

# Masterthesis

Nico Sassano

Entwicklung eines Messsystems zur  
funksynchronisierten elektrochemischen  
Impedanzspektroskopie an Batterie-Zellen

Nico Sassano

Entwicklung eines Messsystems zur  
funksynchronisierten elektrochemischen  
Impedanzspektroskopie an Batterie-Zellen

Masterthesis eingereicht im Rahmen der Masterprüfung  
im gemeinsamen Masterstudiengang Mikroelektronische Systeme  
am Fachbereich Technik  
der Fachhochschule Westküste  
und  
am Department Informations- und Elektrotechnik  
der Fakultät Technik und Informatik  
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Betreuender Prüfer : Prof. Dr.-Ing. Karl-Ragnar Riemschneider  
Zweitgutachter : Prof. Dr.-Ing. Alfred Ebberg

Abgegeben am 14. August 2015

**Nico Sassano**

**Thema der Masterthesis**

Entwicklung eines Messsystems zur funksynchronisierten elektrochemischen Impedanzspektroskopie an Batterie-Zellen

**Stichworte**

Batteriezellsensor, Hardwareentwicklung, funksynchronisierte Messung, verteilte Signalverarbeitung, elektrochemischen Impedanzspektroskopie, Goertzel-Algorithmus, drahtlose Kommunikation

**Kurzzusammenfassung**

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Messsystems zur funksynchronisierten elektrochemischen Impedanzspektroskopie an Batterie-Zellen. Dabei wird eine  $\text{LiFePO}_4$ -Batteriezelle mit einem Wechselstrom angeregt. Der fließende Strom wird dabei durch das Messsystem erfasst. Die durch den Strom verursachte Wechselspannung wird von einem Zellsensor gemessen. Die synchrone Messung von Strom und Spannung wird dabei über ein spezielles proprietäres Funkprotokoll realisiert. Durch die Phasenverschiebung von Strom und Spannung bei unterschiedlichen Frequenzen, lässt sich das Impedanzspektrum der Batteriezelle berechnen.

**Nico Sassano**

**Title of the paper**

Development of a measuring system for radio-synchronised electrochemical impedance spectroscopy on battery cells

**Keywords**

Battery Cell Sensor, hardware development, radio-synchronised measurement, distributed signal processing, electrochemical impedance spectroscopy, Goertzel-Algorithm, wireless communication

**Abstract**

This thesis discusses the development of a measuring system for radio-synchronised electrochemical impedance spectroscopy on battery cells. Therefore, a  $\text{LiFePO}_4$ -battery cell is being stimulated by an ac current and measured by the measuring system. A cell sensor is measuring the ac voltage which has been caused by the ac current. The synchronous measurement of current and voltage is realized by a proprietary wireless protocol. The impedance spectrum is calculated through the phase shiftment of the current and the voltage that occur within different frequencies.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b>	<b>8</b>
1.1. Stand der Technik . . . . .	9
1.2. Motivation und Zielsetzung . . . . .	10
<b>2. Theoretische Grundlagen</b>	<b>12</b>
2.1. Die Lithium-Batterie . . . . .	12
2.1.1. Aufbau einer Lithium-Ionen Zelle . . . . .	14
2.1.2. Elektrochemischer Aufbau . . . . .	17
2.1.3. Batteriealterung . . . . .	24
2.1.4. Zustandsbestimmung einer Zelle . . . . .	26
2.2. Grundlagen der elektrochemischen Impedanzspektroskopie . . . . .	28
2.2.1. Anwendungsbereiche und Funktionsprinzip der EIS . . . . .	28
2.2.2. Mathematische Grundlagen zur Impedanzspektroskopie . . . . .	30
2.2.3. Darstellungsformen der komplexen Impedanz . . . . .	33
2.2.4. Informationen des Impedanzspektrums . . . . .	35
2.2.5. Anregung der Impedanzspektroskopie . . . . .	37
2.3. Batteriemodelle . . . . .	38
2.3.1. Batteriemodell nach Randles . . . . .	39
2.3.2. Optimiertes Batteriemodell . . . . .	44
2.3.3. Alterung am Batteriemodell . . . . .	45
2.4. Reale Batteriealterung . . . . .	47
<b>3. Analyse und Neukonzeption des Messsystems</b>	<b>48</b>
3.1. Aktueller Stand des Messsystems . . . . .	48
3.1.1. Zellsensor . . . . .	49
3.1.2. Batteriesteuergerät . . . . .	53
3.2. Analyse der messtechnischen Anforderungen . . . . .	54
3.2.1. Analyse kommerzieller EIS-Labormessgeräte . . . . .	54
3.2.2. Messfrequenzbereich . . . . .	54
3.2.3. Impedanzbereich . . . . .	56
3.2.4. Spannungsbereich . . . . .	57
3.2.5. Phasengenauigkeit . . . . .	57
3.3. Synchronisation des Messsystems . . . . .	58
3.3.1. Synchronisation der Messwerte . . . . .	58



---

3.3.2.	Synchronisation zwischen den Sensoren . . . . .	62
3.4.	Größe der Messamplitude . . . . .	63
3.4.1.	Impedanzmessung an Batterien . . . . .	63
3.5.	Neukonzeption des Messsystems . . . . .	67
3.5.1.	Messkonzeption für eine hochauflösende Messung . . . . .	67
3.5.2.	Messkonzeption für eine Messung mit analoger Vorverarbeitung . . . . .	76
3.5.3.	Vergleich der vorgestellten Konzepte . . . . .	78
3.6.	Berechnung des Impedanzspektrums durch verteilte Signalverarbeitung . . . . .	80
3.6.1.	Diskrete Fourier-Transformation - DFT . . . . .	81
3.6.2.	Fast Fourier-Transformation - FFT . . . . .	82
3.6.3.	Goertzel-Algorithmus . . . . .	84
3.7.	Abschätzung und Zusammenfassung der Analyse . . . . .	88
<b>4.</b>	<b>Neuentwicklung und Redesign der bestehenden Hardware</b>	<b>90</b>
4.1.	Entwicklung des Batteriesteuergeräts . . . . .	90
4.1.1.	Basismodul des Batteriesteuergeräts . . . . .	91
4.1.2.	Transceiver-Erweiterungsmodul . . . . .	92
4.1.3.	Strommess-Erweiterungsmodul . . . . .	93
4.1.4.	Aufbau des Batteriesteuergeräts . . . . .	94
4.2.	Redesign des Zellsensors . . . . .	95
4.2.1.	Entwicklung der analoge Vorverarbeitung . . . . .	95
4.2.2.	Modifikationen des Schaltungsentwurfs . . . . .	99
4.2.3.	Mechanische- und elektrische Verbindung zwischen Zellsensor und Batteriezelle . . . . .	103
4.2.4.	Platinenlayout des Zellsensors . . . . .	104
4.3.	Hochauflösende AD-Wandler-Erweiterungsplatine . . . . .	106
<b>5.</b>	<b>Softwareentwurf des Messsystems</b>	<b>107</b>
5.1.	Zellsensor Software . . . . .	107
5.1.1.	Speicheroptimierung der Messwerte . . . . .	108
5.1.2.	Dynamische Laufzeitermittlung . . . . .	109
5.1.3.	Steuerung der analogen Vorverarbeitung . . . . .	112
5.2.	Batteriesteuergerät Software . . . . .	116
5.2.1.	Funktionsübersicht des Batteriesteuergeräts . . . . .	117
5.2.2.	Taktaussendung und synchrone Strommessung . . . . .	119
5.3.	Implementierung des Goertzel-Algorithmus . . . . .	120
5.3.1.	Implementierung auf dem Zellsensor . . . . .	120
5.3.2.	Test der implementierten Filterstruktur . . . . .	123
<b>6.</b>	<b>Inbetriebnahme und Erprobung der Impedanzspektroskopie</b>	<b>124</b>
6.1.	Inbetriebnahme der entwickelten Hardware . . . . .	125
6.1.1.	Inbetriebnahme des Batteriesteuergeräts . . . . .	126

---

6.1.2. Inbetriebnahme des Zellsensors . . . . .	128
6.2. Impedanzmessungen . . . . .	138
6.2.1. Vermessung einer Testimpedanz . . . . .	138
6.2.2. Untersuchung der Synchronität des Messsystems . . . . .	143
6.3. Erprobung der Impedanzspektroskopie . . . . .	147
6.3.1. Impedanzmessung einer Batteriezelle . . . . .	148
6.3.2. Messungen an gealterten Batteriezellen . . . . .	150
6.3.3. Impedanzmessung bei verschiedenen Ladezuständen . . . . .	154
6.3.4. Impedanzmessung bei verschiedenen Temperaturen . . . . .	156
6.4. Auswertung und Bewertung der Messergebnisse . . . . .	157
<b>7. Zusammenfassung und Ausblick</b>	<b>159</b>
7.1. Zusammenfassung der Arbeit . . . . .	159
7.2. Ausblick . . . . .	160
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>163</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>164</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>170</b>
<b>A. Hochauflösende AD-Wandler Erweiterungsplatine</b>	<b>178</b>
<b>B. Spannungsversorgungs-Erweiterungsmodul</b>	<b>181</b>
<b>C. Simulation der Schleifenantenne</b>	<b>184</b>
<b>D. Alterung einer Batteriezelle</b>	<b>197</b>
<b>E. Impedanzmessung</b>	<b>199</b>
<b>F. Befehlsübersicht Batteriesteuergerät</b>	<b>203</b>
<b>G. Befestigungsadapter</b>	<b>207</b>
<b>H. PC-lauffähiges Goertzel-Testprogramm</b>	<b>210</b>
<b>I. Aufgabenstellung</b>	<b>213</b>
<b>J. Schaltplan</b>	<b>216</b>
<b>K. Platinenlayout</b>	<b>231</b>
<b>L. Quellcode des Messsystem in C</b>	<b>239</b>

<b>Listings</b>	<b>240</b>
<b>M. Quellcode Matlab Auswertung</b>	<b>409</b>
<b>N. Verzeichnisstruktur des Datenträgers</b>	<b>414</b>

# 1. Einleitung

Aktuell wird versucht, sich von der Abhängigkeit der fossilen Brennstoffen zu lösen. Besonders die sinkenden Erdölvorräte, der damit steigende Treibstoffpreis und der Klimawandel beschleunigen momentan den Willen, nach alternativen Antrieben zu suchen.

Dabei erlebt das Elektroauto in den letzten Jahren eine neue Renaissance. Gefördert von der Politik, der Industrie und der Gesellschaft, wird der Elektroantrieb von Fahrzeugen als zukunftsweisend angesehen. Besonders die Politik ist bemüht, eine ressourcenschonende und umweltfreundliche Alternative zum Verbrennungsmotor auf die Straßen zu bringen. So plant die Bundesregierung aktuell, dass bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge in Deutschland fahren sollen. Diese Zahl soll bis ins Jahr 2030 sogar bis auf sechs Millionen Fahrzeuge steigen [6].

Nach Vorstellungen der Bundesregierung, sollen die Autos mit erneuerbaren Energien geladen werden und fahren somit praktisch ohne Schadstoffausstoß [6]. Dazu hat die Regierung zusammen mit Partnern aus der Industrie die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) als ein Beratungsgremium der Bundesregierung zur Elektromobilität gegründet. Dieses Gremium soll der Bundesregierung Empfehlungen für die Umsetzung der Elektromobilität aussprechen. Ein Problem der Elektromobilität ist momentan die mangelnde Reichweite der Elektrofahrzeuge und die enormen Anschaffungskosten aufgrund der teuren Batterietechnik. Die Regierung versucht, durch Steuerbefreiung und Sonderparkflächen einen Kaufanreiz zu bieten. Dennoch scheuen sich die meisten Autofahrer vor der Anschaffung eines Elektroautos wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batteriezellen.

Deshalb will die Bundesregierung die Forschung und Entwicklung von Batterien zukünftig mit zwei Milliarden Euro fördern, da selbst die neuesten Batteriegenerationen zu schwer sind, um sie wirtschaftlich und mit der erforderlichen Reichweite in Fahrzeuge einzubauen [6]. Die Entwicklung neuer Batterietechnologien kann aber nur als langfristiges Ziel angesehen werden. Als mittelfristiges Ziel wird von der NPE die Forschung an effizienten Elektroniksystemen angegeben. Dabei sei der Schlüssel zu einer intelligenten und nachhaltigen Mobilität unter anderem das Forschungsfeld der Sensorik und des Batteriemangements [15]. Es sollen also aktuelle Batteriesysteme in Kombination mit moderner Elektronik effizient ausgenutzt und somit die Lebensdauer der Batterie gesteigert werden.

## 1.1. Stand der Technik

An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Entwicklung von intelligenter Überwachungssensorik von Batteriezellen beschäftigt. Dabei wird nicht nur die Batterie als Ganzes überwacht, sondern es wird eine Einzelzellüberwachung realisiert. Eine Besonderheit dieser Sensoren ist, dass es sich dabei um eine drahtlose Überwachung handelt. So wird der Batteriesensor von der Zelle versorgt, die er überwachen soll. Die Kommunikation und der Datenaustausch mit einem externen Steuergerät erfolgt dabei über eine Funkschnittstelle. Dies bringt enorme Vorteile mit sich, wie einen geringeren Verkabelungsaufwand, die Verhinderung eines Sensorausfalls durch Kabelbruch und besonders den Vorteil der Potenzialtrennung zwischen den einzelnen Batteriezellen. Die Abbildung 1.1 verdeutlicht dieses Prinzip der Einzelzellüberwachung und der zentralen Steuerung durch ein externes Batteriesteuergerät.

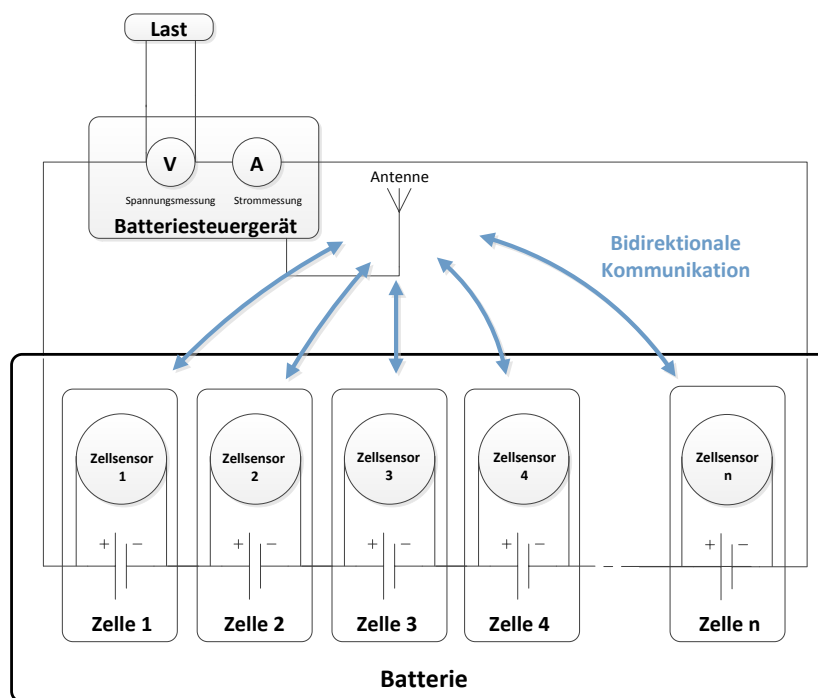


Abbildung 1.1.: Prinzip der Zellüberwachung und des Batteriemangements (ent. aus [62])

Mittels dieser drahtlosen Sensorik können von jeder einzelnen Zelle die Temperatur und Spannung erfasst und überwacht werden. Mit diesen Parametern lässt sich schon eine Zustandsabschätzung der überwachten Batteriezelle machen. Dennoch lassen sich dadurch keine genauen Zustandsbestimmungen der Zelle machen, da diese ausgesprochen schwierig sind [68]. So kann der aktuelle Ladezustand nur näherungsweise anhand der gemessenen Spannung abgeleitet werden. Dabei fließen aber eine Menge Faktoren mit ein, die eine

genaue Bestimmung erschweren.

Eine Bestimmung des Alterungszustands der Zelle ist durch diese Parameter nur bedingt möglich. Doch gerade in Anwendungsbereichen wie der Elektromobilität ist es wichtig, das Altern einer Batteriezelle möglichst frühzeitig zu erkennen, bevor ihre Leistung nachlässt und somit den zuverlässigen Betrieb der gesamten Batterie verhindert.

Für eine genauere Ladungs- und Alterungsbestimmung einer Batteriezelle sind verschiedene Verfahren bekannt. Eines dieser Verfahren ist die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS). Bei der EIS handelt es sich um ein Messverfahren, welches die komplexe Impedanz der Batteriezelle vermisst und daraus auf den Ladungs- und Alterungszustand schließen kann. Diese Messmethode findet sich heute schon in zahlreichen Anwendungsgebieten wieder und ist in der professionellen Batteriediagnostik ein häufig angewandtes Verfahren. Eine Vermessung der komplexen Impedanz ist momentan aber nur mit großen und teuren Labormessgeräten möglich, da es sich dabei um große Leistungselektronik und empfindliche Messtechnik handelt.

Ideal wäre, wenn sich die EIS nicht nur im Labor mit hohem Messaufwand, sondern auch innerhalb des Fahrzeuges an jeder einzelnen Batteriezelle durchführen lassen würde. Dazu muss die eingesetzte Elektronik aber hinsichtlich der Größe optimiert werden. Ein Teil der Forschungsgruppe der HAW Hamburg verfolgt dieses Ziel, die Funktionalität der EIS-Messung direkt auf den Batteriezellen zu integrieren. Dabei soll die Leistungselektronik und die Messelektronik voneinander getrennt werden. Durch eine Optimierung der Messelektronik soll diese komplett auf die drahtlosen Zellsensoren integriert werden.

An diesem Punkt gliedert sich diese Arbeit in das Forschungsprojekt ein. Es soll ein Messsystem, wie es in Abbildung 1.1 gezeigt wurde, entwickelt werden mit dem es möglich ist, die EIS-Messung an jeder einzelnen Zelle durchführen zu können. Dadurch soll das Gesamtziel des Forschungsprojekts, die Erhöhung der Betriebssicherheit und der Lebensdauer der Batteriezelle, erreicht werden.

## 1.2. Motivation und Zielsetzung

Die Diagnostik der Zellparameter ist für sehr viele Anwendungen von Interesse. Durch die Integration eines Zellsensors, der die EIS durchführen kann, würde diese Diagnostik enorm erleichtert werden. Durch eine genauere Abschätzung des Lade- und Alterungszustandes jeder einzelnen Zelle lässt sich die gesamte Batterie effizienter betreiben und senkt somit die Kosten für Wartung und die Neuanschaffung kompletter Batterien, die durch den Ausfall einer Zelle nicht mehr ihre gewünschte Leistung bringen.

Das Ziel dieser Arbeit soll es also sein, ein Messsystem, bestehend aus Batteriesteuergerät

und Zellsensoren zu entwickeln, mit dem es möglich sein soll, die EIS-Messung durchführen zu können. Dieses Messsystem kann auf der Basis von Vorarbeiten der Arbeitsgruppe entwickelt werden. Obwohl diese sich bereits mit den Untersuchungen der EIS-Messung beschäftigt haben, konnte bisher noch keine vollständige Impedanzspektroskopie durchgeführt werden.

Da es sich bei dem Messsystem um ein drahtlos kommunizierendes Konzept handelt, ist es neben der Integration der Messtechnik auf den Zellsensoren auch eine Herausforderung, die Synchronisation der Messwerte zwischen den Stromwerten des Batteriesteuergeräts und den Spannungswerten der Zellsensoren herzustellen. Für die Impedanzmessung ist das Verhältnis von Spannung und Strom und deren Phasenlage enorm wichtig, weshalb diese phasenrichtig gemessen werden müssen. Daher ist besonders auf eine synchrone Strom- und Spannungsaufnahme zu achten. Dies ist bei der Konzeptionierung des Messsystems immer zu beachten.

Aus den Anforderungen des Messsystems lassen sich Fragen ableiten, die diese vorliegende Arbeit beantworten soll.

- Ist es möglich, die gesamte Messelektronik, die für die Erfassung der EIS nötig ist, auf einem kleinen Zellsensor unterbringen?
- Können die Messwerte der Strom- und Spannungsmessung, die für die EIS-Messung nötigen sind, über eine drahtlos kommunizierende Schnittstelle soweit synchronisieren werden, dass eine phasenrichtige Aufnahme von Strom- und Spannung in ausreichender Genauigkeit möglich ist?
- Wenn eine ausreichende Synchronisierung der Messwerte gelingt, ist die Frage ob sich mit dem Messsystem EIS-Messungen durchführen lassen, die mit einem herkömmlichen Labormessgerät vergleichbar sind?
- Gelingen Messungen mit dem entwickelten Messsystem, so ist zu überprüfen, ob diese präzise genug sind, um Veränderungen der Parameter der Alterung, des Ladezustands oder der Temperatur zu detektieren.

Die Lösungen müssen im Laufe dieser Arbeit erarbeitet und anschließend überprüft werden. Gelingt die Integration der EIS-Messmethode auf den Zellsensoren, wäre dies ein großer Fortschritt für die Arbeitsgruppe und würde dem Ziel, einer effizienteren Nutzung der Batteriezelle und damit eine längere Betriebsdauer zu erreichen, ein großes Stück näher kommen.

## 2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die relevanten Grundlagen für das Verständnis der elektrochemischen Impedanzspektroskopie und deren Auswertung dargestellt werden. So werden der grundlegende chemische Aufbau sowie die elektrochemischen Vorgänge der Batterie erläutert und anhand eines bekannten Batteriemodells analysiert.

Des Weiteren wird in diesem Kapitel ein Überblick über den im Impedanzspektrum steckenden Informationsgehalt gegeben.

### Grundlagen der Elektrochemie

In dieser Arbeit werden ausschließlich Lithium-Ionen-Akkumulatoren verwendet. Daher werden im Folgenden die grundlegenden Themen der Elektrochemie für Lithium-Ionen-Akkumulatoren erklärt, die zum Verständnis der elektrochemischen Impedanzspektroskopie nötig sind.

#### 2.1. Die Lithium-Batterie

Seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde versucht, Batterien auf der Basis von Lithium aufzubauen. Der Vorteil der Lithium-Technologie ist die hohe Spannungslage und die hohe Energiedichte. Zudem hat sie flache Entladungskurven und ein sehr gutes Lagerverhalten mit einer geringen Selbstentladung.

Zunächst wurden damit Primärzellen hergestellt, d.h. diese waren nicht wiederaufladbar. Diese Primärzellen bestanden aus Lithium-Metall für die Anode und aus Braunstein ( $\text{MnO}_2$ ) als Kathode [68]. Wiederaufladbare Lithium-Batteriezellen waren zu dieser Zeit aus Sicherheitsgründen nicht verfügbar. Grund hierfür war die starke Reaktionsfähigkeit von Lithium mit Wasser, wobei reaktiver Wasserstoff entsteht.

Erst 1991 brachte Sony eine Sekundärbatterie auf Basis von Lithium auf den Markt. Dabei wurde aber nicht mehr reines Lithium als Kathodenmaterial verwendet, sondern Lithium-Cobalt-Dioxid, kurz  $\text{LiCoO}_2$ . Als Anodenmaterial wurde zunächst amorpher Kohlenstoff verwendet, später dann Graphit. Diese Art der Lithiumzellen sind heute noch eine gängigen sekundären Batterie auf dem Markt. Vor allem im mobilen Sektor, wie Mobilfunkgeräten



oder Notebooks wird diese Batterietechnologie aufgrund ihrer hohen Energiedichte und des geringen Gewichts eingesetzt. Im Laufe der Zeit kamen eine Vielzahl von Zellen auf den Markt, bei denen unterschiedliche Aktivmaterialien für die Lithium-Ionen-Zelle eingesetzt wurden. Eine Auswahl der Materialien und deren unterschiedlich liegenden Potenziale zeigt die Abbildung 2.1.

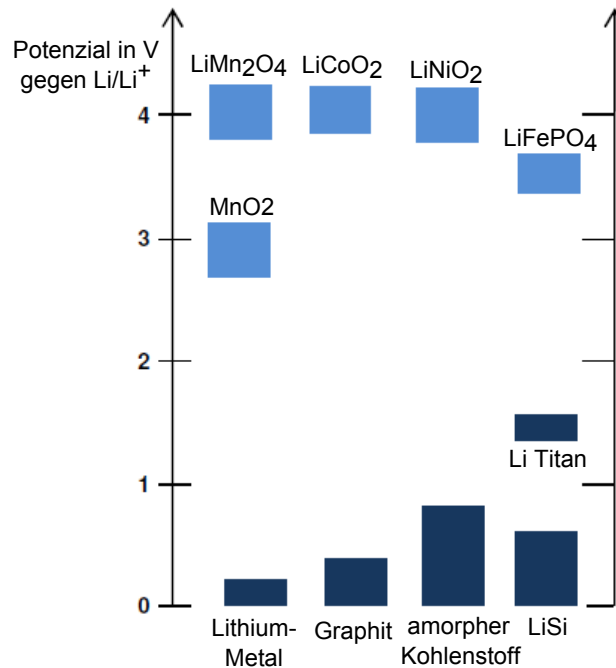


Abbildung 2.1.: Potenzialbereich verschiedener Aktivmaterialien (nach [72])

Je nach Anwendungsbereich werden unterschiedliche Kombinationen für das Anoden/Kathoden Material verwendet. Unterschiede bestehen dabei zum einen in der möglichen Zellspannung und zum anderen in der spezifischen Energie, d.h. wieviel Ladung pro kg die Zelle enthält. Ein weiterer Unterschied ist, ob die Zelle eher für den Hochstrombetrieb oder für Hochenergie-Anwendungen genutzt wird. Dabei wird meist das Kathodenmaterial geändert, für das Anodenmaterial wird derzeit überwiegend Graphit eingesetzt.

Im Kleingeräte-Markt, in dem vor allem mobile Geräte im Vordergrund stehen, wird heutzutage meist LiCoO<sub>2</sub> als Kathodenmaterial verwendet. Für Anwendungen im Hochstrombereich, wie Traktionsbatterien, wird Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO<sub>4</sub>) eingesetzt. Diese sind wegen ihrer guten Hochstromfähigkeit und besonders wegen ihrer Sicherheit sehr gut für den Einsatz in der Elektromobilität geeignet. In dieser Arbeit werden deshalb alle Anforderungen und Messungen an LiFePO<sub>4</sub> Zellen durchgeführt.

### 2.1.1. Aufbau einer Lithium-Ionen Zelle

In diesem Abschnitt soll ein Überblick über den Aufbau einer Lithium-Ionen Zelle gegeben werden. Die Lithium-Ionen Batterie lässt sich prinzipiell wie in Abbildung 2.2 darstellen, bestehend aus zwei Elektroden, einem zwischen den Elektroden liegenden Separator, dem Elektrolyten und den Stromableitern.

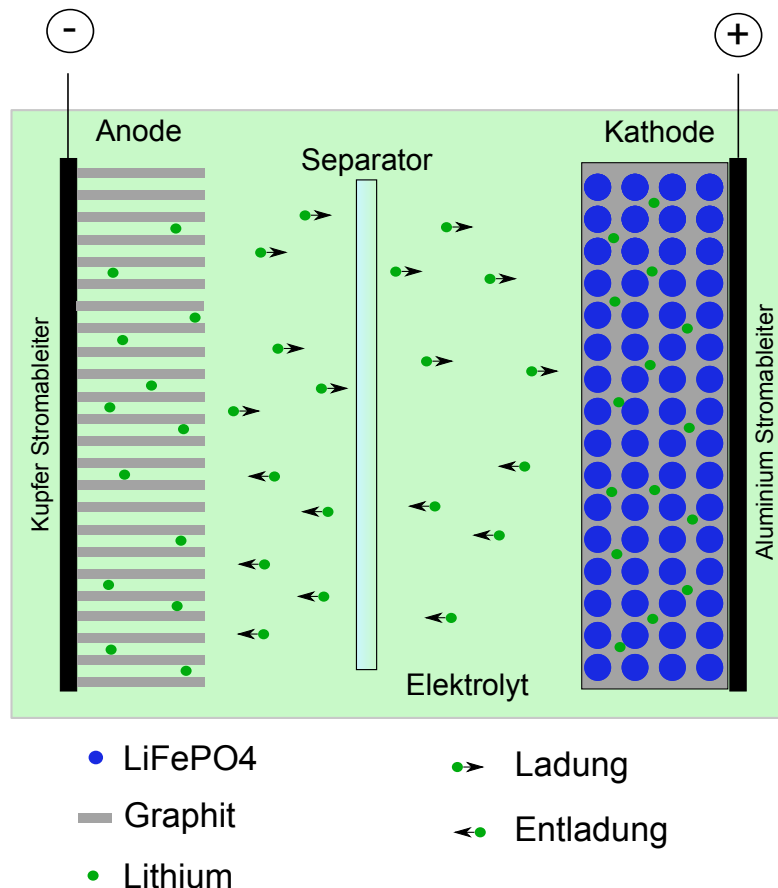


Abbildung 2.2.: Prinzipieller Aufbau einer LiFePO<sub>4</sub> Zelle (nach [72] [61])

Als Stromableiter wird meist Kupfer und Aluminium verwendet. Dabei wird an der negativen Elektrode Kupfer verwendet. An der positiven Seite kann kein Kupfer verwendet werden, da es hier zu starken Korrodierungen kommen kann [68]. Deshalb kommt hier das etwas schlechter leitende Aluminium als Ableiter zum Einsatz.

Als Elektrodenmaterial können verschiedene Materialien zum Einsatz kommen. Von der Auswahl dieser Materialien hängt u.a. auch die Spannung der Zelle, ihre Kapazität und die Sicherheit ab.

## Kathode

Als Kathodenmaterial kommen in der Lithium-Ionen-Technologie meist Metalloxide mit eingelagertem Lithium zum Einsatz. Ein verbreitetes Kathodenmaterial ist Lithium-Cobalt-Dioxid  $\text{LiCoO}_2$ . Es besitzt eine mittlere Entladespannung von 3,9 V. Ein großes Problem dieses Materials ist die Gefahr von exothermen Reaktionen oberhalb von 4,4 V oder bei hohen Temperaturen. Deshalb ist beim Einsatz dieses Kathodenmaterials zwingend eine elektronische Überwachung der Zellen notwendig, um ein Überladen oder ein Überhitzen zu verhindern.

Ein weiteres Kathodenmaterial ist lithiiertes Manganoxid  $\text{LiMn}_2\text{O}_4$ . Dieses besitzt eine mittlere Entladespannung von 4,0 V. Der Vorteil dieses Materials ist sein gutes Sicherheitsverhalten bei hohen Temperaturen. Nachteil dabei ist aber eine bis zu 20 % geringere Energiedichte als bei  $\text{LiCoO}_2$ . Eingesetzt wird dieses Material vor allem im gemischten Zustand mit  $\text{LiCoO}_2$  im Mittelstrombereich.

Sehr gute Hochstromeigenschaften hat das Lithium-Nickel-Oxid  $\text{LiNiO}_2$ . Es hat dabei eine mittlere Entladespannung von 3,8 V und eine sehr gute Energiedichte. Es wäre somit sehr gut geeignet für Traktionsbatterien. Der große Nachteil dieses Kathodenmaterials ist das sehr kritische Sicherheitsverhalten. Daher wird es nicht für Traktionsbatterien eingesetzt.

Im Gegensatz zu den zuvor aufgeführten Kathodenmaterialien handelt es sich bei Lithium-Eisen-Phosphat  $\text{LiFePO}_4$  um kein Oxid, sondern um ein Phosphat. Es wird also kein Sauerstoff freigesetzt, was dieses Kathodenmaterial sicher und thermisch stabil macht. Das Material besitzt eine hohe Kapazität in mAh/g und eine hohe Leistungsdichte, jedoch eine mittlere Spannung von nur 3,4 V. Die Energiedichte ist daher geringer als bei den zuvor vorgestellten Kathodenmaterialien. Die hohe Leistungsdichte und die guten Sicherheits-eigenschaften machen dieses Kathodenmaterial zu einem sehr guten Kandidaten für den Einsatz in Fahrzeugbatterien.

Die in dieser Arbeit verwendeten Batteriezellen verwenden alle als Kathodenmaterial  $\text{LiFePO}_4$ .

Tabelle 2.1.: Übersicht der Kathodenmaterialien (nach [68])

	$\text{LiCoO}_2$	$\text{LiMn}_2\text{O}_4$	$\text{LiNiO}_2$	$\text{LiFePO}_4$
Mittlere Spannung	3,9 V	4,0 V	3,8 V	3,4 V
Kapazität in mAh/g	150	120	170	160
Energiedichte	+	-	++	--
Sicherheit	-	+	-	++

**Anode**

Bei der Markteinführung der Lithium-Ionen Technologie wurde zunächst amorpher Kohlenstoff als Anodenmaterial verwendet, welcher eine Speicherkapazität von etwa 200 mAh/g aufweist [68]. Aufgrund der höheren Speicherkapazität von ca. 372 mAh/g [68] und dem ähnlich guten Sicherheitsverhalten für Lithium-Ionen wurde dann kurze Zeit später Graphit eingesetzt. Dieses wird auch noch heute verwendet.

**Elektrolyt**

Der Elektrolyt dient als Leitmedium für den Ionentransport zwischen den beiden Elektroden. Zum größten Teil besteht der Elektrolyt aus Lösungsmitteln und verschiedenen Leitsalzen. Im Gegensatz zu Blei- oder Nickelbatterien können bei Lithium-Ionen-Batterien keine wässrigen Elektrolyten eingesetzt werden, da Wasser sich bereits bei Spannungen unter 3 V zersetzt. Statt dessen werden organische Elektrolyte eingesetzt. Deren Nachteil ist allerdings eine deutlich schlechtere Ionenleitfähigkeit als bei wässrigen Elektrolyten [68].

**Separator**

Der Separator dient der elektrischen Isolation zwischen den beiden Elektroden. Er stellt also sicher, dass es zu keinem Kurzschluss zwischen Anode und Kathode kommt. Der Separator besteht aus einer hochporösen Plastikfolie, die aus Polyethylen (PE) oder auch aus Polypropylen (PP) besteht. Neben der elektrisch isolierenden Eigenschaft muss der Separator aber leitfähig für den Ionentransport zwischen Anode und Kathode sein. Dies erreicht er durch eine hohe Porosität.

Neben diesen Eigenschaften dient der Separator auch als Sicherheitselement innerhalb der Zelle. Bei zu hohen Temperaturen schmilzt er und unterbricht somit die Ionenleitfähigkeit, weshalb kein Strom mehr fließen kann. Dieser Sicherheitsmechanismus wird auch als "shut down"-Mechanismus bezeichnet [51].

**SEI-Schicht**

Die sogenannte SEI-Schicht (Solid Electrolyte Interface) ist eine Grenzschicht, die sich zwischen der negativen Elektrode und dem Elektrolyten ausbildet. Sie ist notwendig, um die Anodenseite von dem Elektrolyten zu trennen, da der Elektrolyt an der katalytisch wirkenden Kohlenstoffanode ansonsten fortlaufend zersetzt werden würde. Die SEI-Schicht bildet sich während der ersten Zyklen als Zersetzungsprodukt des Elektrolyten und wirkt als inertisierende Schutzschicht. Allerdings erschwert sie auch die Ionenleitfähigkeit der Zelle. Die unkontrollierte Ausbildung der SEI-Schicht ist, neben der fortlaufenden Schädigung der Elektroden, maßgeblich für die Alterung der Zelle verantwortlich [61]. Ziel für die Herstellung der Zellen ist es also, eine möglichst kontrollierte und dünne SEI-Schicht zu erzeugen, um die Ionenleitfähigkeit langfristig zu erhalten. Dies kann durch entsprechende Zugabe von Salzen zum Elektrolyten sowie die gezielte Steuerung der ersten Zellzyklen erreicht werden [68]. Über den Einfluss der SEI-Schicht auf die Alterung der Batteriezelle wird in Abschnitt 2.1.3 nochmals näher eingegangen.

### 2.1.2. Elektrochemischer Aufbau

In diesem Abschnitt soll der elektrochemische Aufbau der Zelle anhand von einzelnen Spannungen erläutert werden. Dabei lässt sich eine elektrochemische Zelle als Zusammenschaltung verschiedener Spannungsquellen beschreiben [68].

Zum einen ist dies die eigentliche Ruhespannung  $U_0$  der Batteriezelle. Zum anderen sind es Spannungen, die innerhalb der Zelle auftreten, wenn diese mit dem Strom  $I$  durchflossen wird. Diese Spannungen nennen sich Überspannung  $\eta_i$  [68] und werden durch Spannungsabfälle innerhalb der Zelle verursacht. Sie lassen sich in verschiedene einzelne Überspannungen einteilen. Dabei tragen alle einzelnen Überspannungen eines elektrochemischen Gesamtprozesses zur Gesamtspannung  $U$  der Zelle bei und können mit der nachfolgenden Formel zusammengefasst werden [24]:

$$U = U_0 \pm \sum_i \eta_i \quad (2.1)$$

Diese Überspannungen werden im Falle des Ladens der Zelle zusammen mit der Ruhespannung addiert. Im Falle einer Entladung werden diese von der Ruhespannung abgezogen. Vereinfacht gesagt, tragen die Überspannungen beim Laden einer Zelle zu einer Spannungserhöhung und beim Entladen zu einer Spannungsreduzierung der Gesamtspannung  $U$  bei [68]. In Abbildung 2.3 ist dieses Prinzip vereinfacht dargestellt. Dabei ist der Fall einer Ladung der Zelle gezeigt. Im umgekehrten Fall, also einer Entladung, drehen sich die Spannungsrichtungen der Überspannungen um. Dabei werden dann die Überspannungen von der Ruhespannung abgezogen.

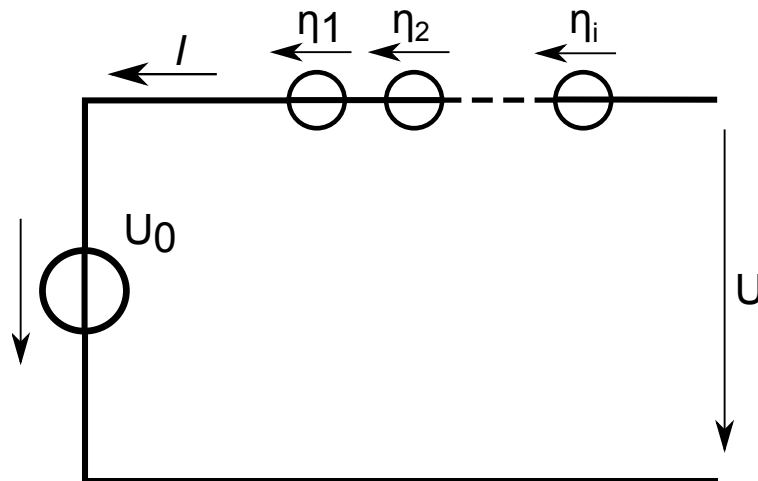


Abbildung 2.3.: Überspannungen an einer Zelle im Ladefall (nach [68])

Die Ursache dieser Überspannungen ist die begrenzte Leitfähigkeit der Materialien und der elektrochemischen Vorgänge innerhalb der Zelle. Fließt durch diese ein Strom, so entsteht

daran eine Überspannung. Nach [68] lassen sich die einzelnen Überspannungen einer Zelle vereinfacht in die folgenden Typen einteilen:

- Ohmsche Überspannung
- Durchtrittsüberspannung
- Diffusionsüberspannung

Im Folgenden werden diese Überspannungen näher betrachtet. Ziel dabei ist es, mit Hilfe der einzelnen Überspannungen ein Modell der Zelle aus elektrischen Elementen zu erstellen und den Aufbau zu verstehen.

Solch ein Batteriemodell, wie es aus der Literatur bekannt ist, soll eine quantitative Auswertung des Batteriezustandes ermöglichen. Dabei wird das Modell meist aus einfachen elektronischen Grundbausteinen wie Widerstand, Induktivität und Kapazität aufgebaut, können aber auch aus komplexen Bausteinen bestehen.

### Ohmsche Überspannung

Die ohmsche Überspannung entsteht an den ohmschen Widerständen der Zelle. Diese setzen sich aus dem Widerstand der metallischen Ableiter, dem Widerstand des Elektrolyten und dem ohmschen Widerstand des Aktivmaterials zusammen. Der Großteil dieses Widerstandes wird durch den Elektrolyt verursacht [68], weshalb dieser hier als  $R_E$  (Elektrolyt-Widerstand) bezeichnet wird.

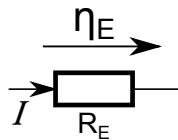


Abbildung 2.4.: Ohmsche Überspannung am Batteriemodell

Der ohmsche Widerstand steht in starker Abhängigkeit mit dem Alterszustand der Zelle [68]. So verändert sich mit zunehmendem Alterungszustand nicht nur die Leitfähigkeit des Elektrolyten, sondern es verändert sich vor allem der Widerstand des Aktivmaterials, verursacht durch eine Erhöhung des Übergangswiderstandes von der Elektrode zum Elektrolyten durch die Bildung der SEI-Deckschicht und der Beschädigung des Aktivmaterials [68].

### Durchtrittsüberspannung

Eine weitere Überspannung ist die sogenannte Durchtrittsüberspannung. Diese wird durch den vom Strom  $I$  durchflossenen Gleichstromwiderstand  $R_{ct}$  (charge transfer Widerstand) verursacht, der in Reihe mit dem Widerstand  $R_E$  liegt [42].

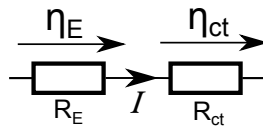


Abbildung 2.5.: Durchtrittsüberspannung am Batteriemodell

Durch das Anlegen einer Wechselfspannung bzw. eines Wechselstromes wird die Zelle im Rhythmus der angelegten Frequenz angeregt. Dies bedeutet, dass die chemischen Vorgänge innerhalb der Zelle der Anregungsfrequenz folgen. Bei einer Anregungsfrequenz oberhalb von 1 Hz können diese nur noch einen quasistationären Zustand einnehmen [24]. Dies bedeutet, dass die Hin- und Rückreaktionen nicht mehr gleich schnell ablaufen können und es zu einer Verschiebung kommt. Es resultiert daraus eine Verschiebung des Ladungsdurchtritts  $i$  an den Elektroden. Dieses Verhalten lässt sich mittels des nichtlinearen Widerstandes  $R_{ct}$  beschreiben. Der Strom, der durch den Widerstand fließt, folgt der Kennlinie der Butler-Volmer-Gleichung 2.2 [24]. Sie beschreibt diese Verschiebung des Ladungsdurchtritts in Abhängigkeit des Durchtrittsfaktors  $\alpha$  und der Austauschstromdichte  $i_0$ .

$$i = i_0 \left[ \underbrace{\exp\left(\frac{\alpha \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \eta\right)}_{\text{Hinreaktion}} - \underbrace{\exp\left(-\frac{(1 - \alpha) \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \eta\right)}_{\text{Rückreaktion}} \right] \quad (2.2)$$

Der Durchtrittsfaktor  $\alpha$  gibt die Symmetrie der Hin- und Rückreaktion an. Das  $\alpha$  kann dabei einen Wertebereich von 0 bis 1 annehmen.

$n$  gibt die Anzahl der an der Reaktion beteiligten Elektronen an,  $F$  ist die faradaysche Konstante<sup>1</sup>,  $R$  ist die allgemeine Gaskonstante<sup>2</sup> und  $T$  gibt die absolute Temperatur in Kelvin an.

<sup>1</sup> $F = 96485.3365 \text{ C/mol}$

<sup>2</sup> $R = 8,3144621 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$

Im Folgenden wird die Butler-Volmer-Kennlinie für  $\alpha = 0.5$  gezeigt. Dies bedeutet, dass die Hin- und Rückreaktionen gleich schnell ablaufen.

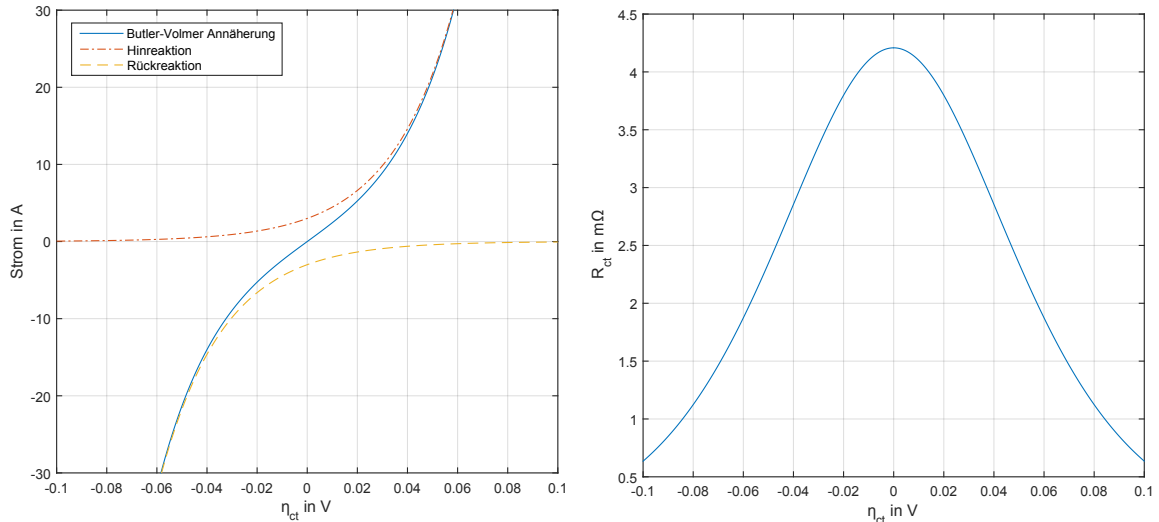


Abbildung 2.6.: Im linken Bild ist die Butler-Volmer-Annäherung mit  $i_0 = 3 \text{ A}$ ,  $\alpha = 0.5$ ,  $T = 293 \text{ K}$  und  $n = 2$  zu sehen.

Im rechten Bild ist der Durchtrittswiderstand in Abhängigkeit der Überspannung  $\eta_{ct}$  zu sehen (nach [42]).

Im linken Teil der Abbildung 2.6 ist zum einen die Strom-/Spannungskennlinie der Butler-Volmer-Kennlinie zu sehen. Man erkennt eine starke Nichtlinearität zwischen der Überspannung  $\eta_{ct}$  und dem Strom.

Im rechten Teil der Abbildung ist der nichtlineare Widerstand  $R_{ct}$ , in Abhängigkeit der Überspannung  $\eta_{ct}$ , zu sehen. Dabei erkennt man, dass der Widerstand  $R_{ct}$  für große Ströme kleiner wird.



## Doppelschichtkapazität

Beeinflusst wird die Durchtrittsüberspannung durch die Doppelschichtkapazität an den Elektroden. Wird eine Metallelektrode in einen Elektrolyten getaucht, entsteht an der Oberfläche der Elektrode eine Reaktion. Dabei entsteht die elektrochemische Doppelschicht an der Phasengrenze zwischen der Elektrode und dem Elektrolyten. Es stehen sich also zwei unterschiedlich geladene Potenziale gegenüber.

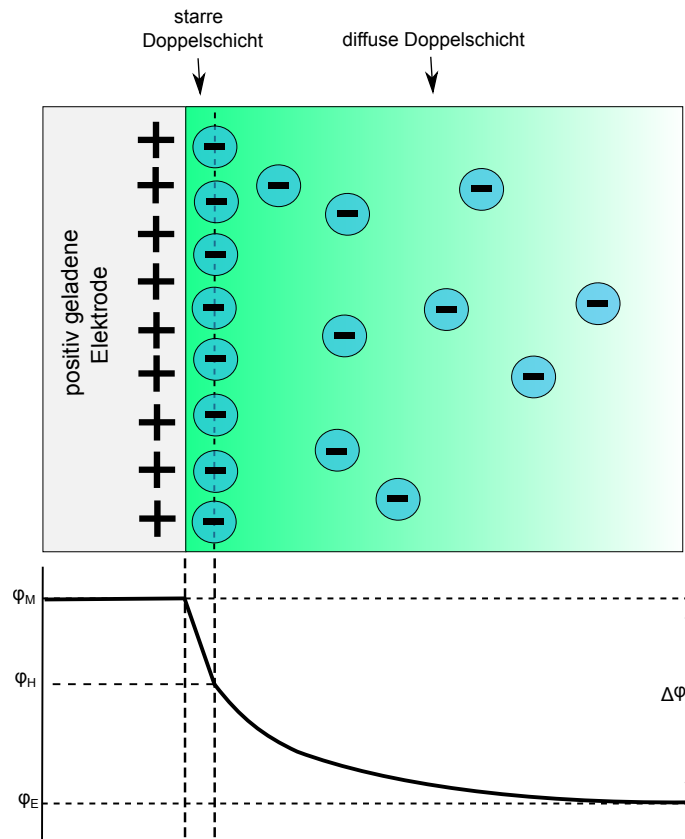


Abbildung 2.7.: Doppelschichtmodell mit Potenzialverlauf (nach [24])

$\varphi_M$  ist das Potenzial der Elektrode

$\varphi_H$  ist das Potenzial an der äußeren Helmholtzschicht

$\varphi_E$  ist das Potenzial des Elektrolyten

$\Delta\varphi$  ist die Galvanispannung

An der Grenze der Doppelschicht bildet sich eine Kapazität mit der Ladung  $Q$ . Diese Ladung lässt sich in erster Näherung als normaler Plattenkondensator beschreiben. Dabei ist

die Ladung der Platten

$$Q = C \cdot U$$

Die Spannung  $U$  ist dabei der Potenzialunterschied  $\Delta\varphi$  zwischen der Elektrode  $\varphi_M$  und dem Elektrolyten  $\varphi_E$ . Dieser wird beschrieben durch die Galvanispannung  $\Delta\varphi$ , wie sie auch in Abbildung 2.7 zu sehen ist.

$$\Delta\varphi = \varphi_M - \varphi_E$$

Berechnung der Doppelschichtkapazität  $C_{dl}$  mit der Galvanispannung:

$$C_{dl} = \frac{Q}{\Delta\varphi - \varphi_{Null}} \quad (2.3)$$

Durch das Verhältnis der großen Ladung  $Q$ , verursacht durch die große Oberfläche der Aktivmasse, zur kleinen Galvanispannung  $\Delta\varphi$ , entsteht eine sehr große Kapazität. Diese Kapazität verursacht zwar keine Überspannung, dennoch beeinflusst die Doppelschichtkapazität die Überspannung am Widerstand  $R_{ct}$ .

Diese Kapazität liegt im verwendeten Batteriezellenmodell parallel zum Widerstand  $R_{ct}$  und bildet somit ein RC-Glied.

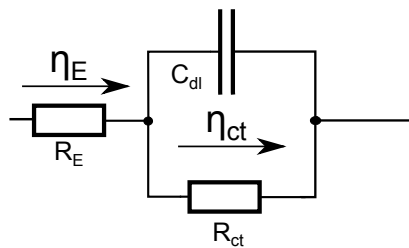


Abbildung 2.8.: Ohmsche Überspannung: Doppelschichtkapazität

Für Metallelektroden im Elektrolyten kann für eine erste Abschätzung der Kapazität etwa  $30 \mu F$  pro  $1 \text{ cm}^2$  Elektrodenoberfläche angenommen werden [19].

### Diffusionsüberspannung am Batteriemodell

Die Diffusionsüberspannung entsteht durch den Konzentrationsunterschied der Ionen zwischen der Elektrode und dem Elektrolyten. Diese Spannung hängt also von der vorhandenen Ionenladung innerhalb der Batteriezelle ab. In dem gewählten Batteriemodell lässt sich die Diffusionsüberspannung mit der Warburg-Impedanz  $Z_W$  darstellen. Die Warburg-Impedanz ist eine komplexe Impedanz, welche die Diffusion der einzelnen Ladungsträger innerhalb des Elektrolyten beschreibt. Beschreiben lässt sich die Impedanz nach Formel 2.4 [46].

$$Z_W = \sigma (\omega)^{-1/2} \cdot (1 - j) \quad (2.4)$$

Dabei wird  $\sigma$  als Warburg-Koeffizient bezeichnet, der hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt wird [46].

$$\sigma = \frac{R \cdot T}{n^2 F^2 A \sqrt{2}} \cdot \left( \frac{1}{C_0 \sqrt{D_0}} + \frac{1}{C_R \sqrt{D_R}} \right) \left[ \frac{\Omega}{\sqrt{\text{sek.}}} \right] \quad (2.5)$$

Die folgende Abbildung zeigt die Warburg-Impedanz als Bode- sowie als Nyquist-Plot.

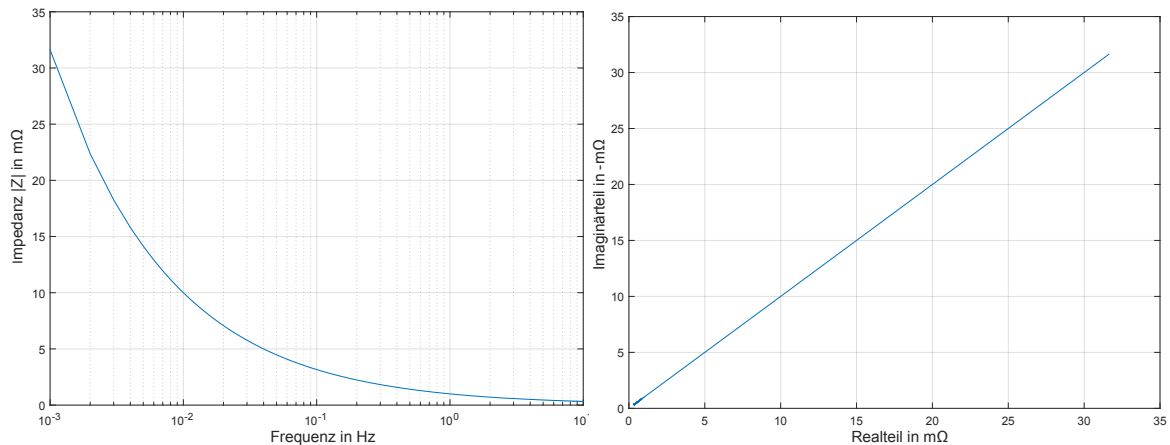


Abbildung 2.9.: Im linken Bild ist der Betrag der Impedanz  $Z$  logarithmisch über der Frequenz dargestellt. Im rechten Bild ist der Imaginärteil in Abhängigkeit des Realteils aufgetragen

In der linken Abbildung ist zu sehen, dass die Impedanz mit steigender Frequenz stark abnimmt, d.h. dass deren Einfluss erst mit niedriger Frequenz eintritt. In der rechten Abbildung ist die für die Warburg-Impedanz typische Steigung von  $45^\circ$  (für  $\sigma = 1$ ) zu sehen. Die Warburg-Impedanz fügt sich im Batteriemodell in Reihe mit dem Widerstand  $R_{ct}$  ein [42]. Abbildung 2.10 zeigt das Batteriemodell mit allen drei beschriebenen Überspannungen.

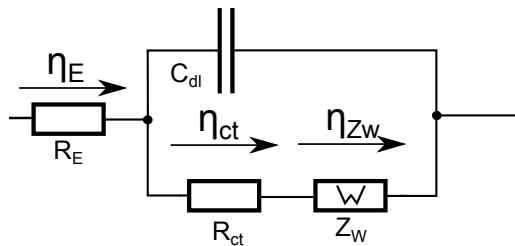


Abbildung 2.10.: Vollständiges Batteriemodell der drei Überspannungen

### 2.1.3. Batteriealterung

Die Alterung einer Batteriezelle wird überwiegend durch chemische Prozesse hervorgerufen. Dabei kommt es zu einer Erhöhung des Innenwiderstands der Zelle. Ebenfalls kommt es zu einem irreversiblen Kapazitätsverlust der Batteriezelle. Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie die Batteriezelle altern kann. Zum einen ist es die normale kalendarische Alterung der Zelle. Diese kalendarische Alterung wird im Wesentlichen durch das kontinuierliche Wachstum von SEI-Deckschichten verursacht. Zum anderen wird die Zelle durch ihre Nutzung gealtert. Dabei entstehen mechanische Belastungen, durch die Veränderungen des Aktivmaterials. Dadurch entstehen irreversible Kapazitätsverluste an der Batteriezelle, die zur Alterung führen [68] [61].

#### Kalendarische Alterung durch SEI-Wachstum

Die Hauptursache für die Alterung ist die Erhöhung des Innenwiderstands, hervorgerufen durch die Deckschichtbildung der SEI-Schicht [25]. Wie in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, bildet sich die SEI-Deckschicht bereits bei der Herstellung der Zelle an der negativen Elektrode und wächst mit der Zeit weiter an. Dies vermindert die Ionen-Leitfähigkeit zwischen Aktivmaterial und Elektrolyt, weshalb der Innenwiderstand der Zelle mit zunehmender Alterung steigt. Abbildung 2.11 zeigt das Prinzip des SEI-Wachstums und den daraus erhöhten Widerstand für den Lithium Transport.

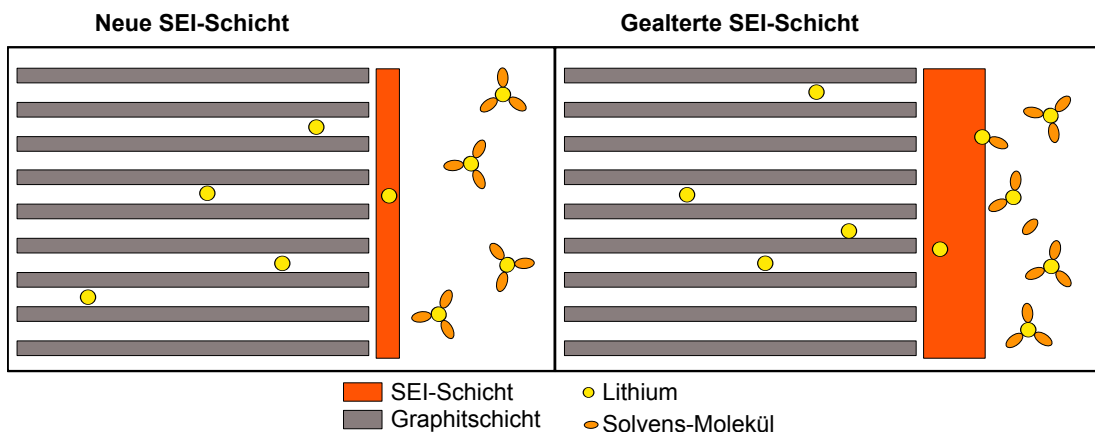


Abbildung 2.11.: Prinzip SEI-Wachstum (nach [61])

In der Abbildung 2.12 (entnommen aus [26]) ist eine Elektrodenmikroskopaufnahme von neuem und altem  $\text{LiFePO}_4$  Material gegenübergestellt. Dieses Material wurde für mehrere Monate gelagert. Deutlich zu sehen ist die Veränderung der Oberfläche des gealterten Materials. Laut [17] entspricht die SEI-Schicht der weißen Oberflächen, die in der Abbildung zu sehen sind.

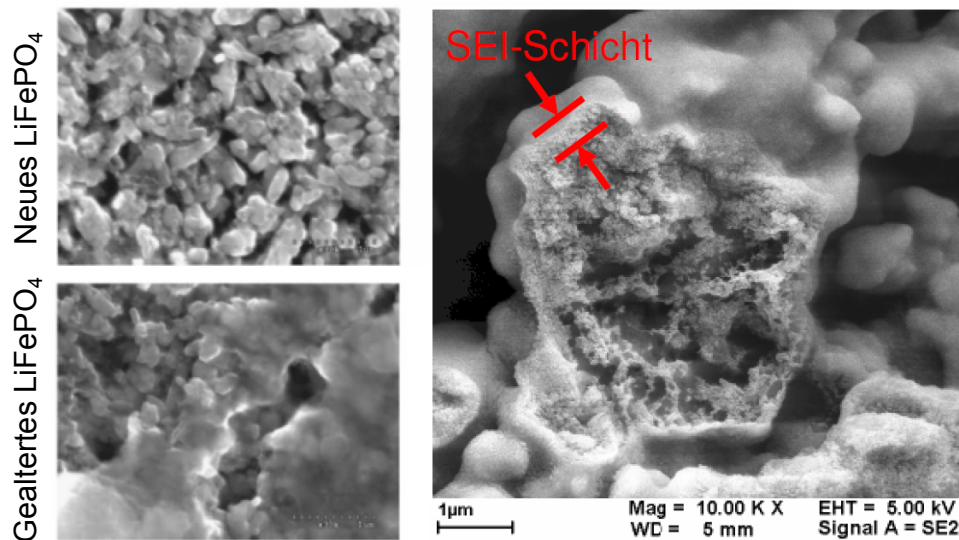


Abbildung 2.12.: SEI Wachstum am gealterten  $\text{LiFePO}_4$  Material (ent. aus [26] [45])

Neben dem kontinuierlichen Wachstum der SEI-Schicht, wird das Wachstum durch verschiedene Faktoren teilweise stark beschleunigt. So ist die Lagerung oder der Betrieb der Batteriezelle in hohen Temperaturbereichen ( $>50^\circ\text{C}$ ) [26] für ein beschleunigtes Wachstum der SEI-Schicht verantwortlich und fördert somit die Alterung der Batteriezelle.

### Alterung durch Zyklierung

Ein weiterer Alterungseffekt tritt durch den normalen Betrieb der Zelle auf. Durch die Zyklierung der Zelle werden Lithium-Ionen innerhalb der Graphitschicht ein- und ausgelagert. Dieses Ein- und Auslagern führt zu einer Volumenänderung des Aktivmaterials. Durch die mechanische Belastung kommt es zu einem Aufbrechen der Graphitstruktur, in der sich wiederum eine Deckschicht bildet. Durch diese Reaktion reduziert sich schließlich die aktive Elektrodenoberfläche, was einen Kapazitätsverlust zur Folge hat.

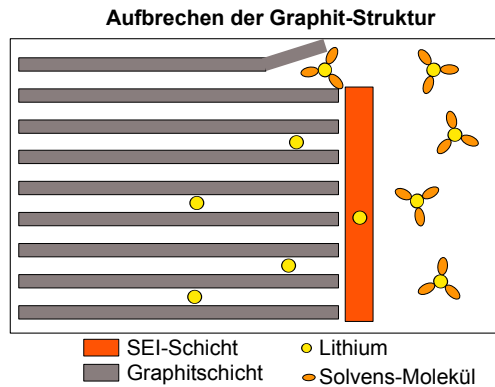


Abbildung 2.13.: Aufbrechen der Graphit-Struktur (nach [26])

Des Weiteren kommt es durch die Volumenänderung zu Kontaktverlusten zwischen dem Aktivmaterial und dessen Stromableiter. Somit wird auch an dieser Stelle die Leitfähigkeit verschlechtert und der Widerstand der Zelle steigt an.

#### 2.1.4. Zustandsbestimmung einer Zelle

In diesem Abschnitt sollen einige Begriffe erklärt werden, die im Zusammenhang mit der Zustandsbestimmung der Batteriezelle auftauchen.

##### Elektrische Ladung einer Zelle

Bei der Kapazität einer Zelle ist zwischen der Nennkapazität und der momentan tatsächlich vorhandene Kapazität zu unterscheiden. Die Nennkapazität  $C_N$  ist die von Hersteller angegebene Kapazität. Die Kapazität  $C_m$  ist die im momentan tatsächliche vorhandene Kapazität, wie in Abbildung 2.14 zu sehen ist. Diese ist, bedingt durch Alterung der Zelle, immer kleiner als die Nennkapazität.

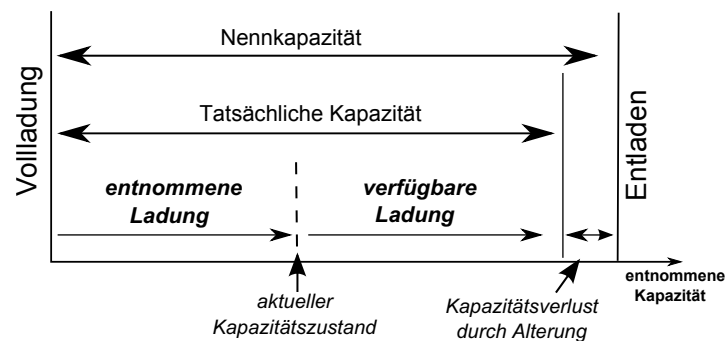


Abbildung 2.14.: Tatsächliche Kapazität einer Zelle (nach [68])

### Gesundheitszustand einer Zelle - State of Health und End of Life

Der State of Health (SoH) gibt als Quotient aus Ist-Kapazität und Nennkapazität eine Aussage über den Grad der Alterung einer Batteriezelle [47]. Dabei wird eine neue Zelle mit einem SoH von 100% bewertet. Mit fortschreitender Alterung fällt der SoH bis zu einem Wert von 0%. Der Bereich, an dem die Batteriezelle noch ca. 60-80%<sup>3</sup> ihrer Nennkapazität besitzt, wird auch der End of Life (EoL) genannt. Ab diesem Bereich fällt die noch vorhandene Kapazität der Batteriezelle mit jedem Zyklus stark ab [68], bis der Zustand von 0% SoH erreicht ist. Der Gesundheitszustand der Zelle lässt sich anhand der noch vorhandenen Kapazität  $C_m$  und der Nennkapazität  $C_N$  berechnen.

$$\text{SoH} = \frac{C_m}{C_N} \quad (2.6)$$

### Ladezustand einer Zelle - State of Charge und Depth of Discharge

Der Ladezustand einer Zelle wird als State of Charge (SoC) bezeichnet. Dieser gibt den aktuellen Ladezustand der Zelle an, im Verhältnis zu ihrer Nennkapazität. Der Ladezustand wird dabei im Bereich vom 0 % für eine vollkommen entladene Zelle bis zu 100 % für eine voll geladene Zelle angegeben.

$$\text{SoC} = \frac{C_N - \text{Entnommene Ladung}}{C_N} \quad (2.7)$$

Eine alternative Angabe für den Ladezustand einer Zelle wird durch die Entladungstiefe, welche auch "Depth of Discharge (DoD)" genannt wird, angegeben. Bei einer voll geladenen Batteriezelle wird der DoD zu 0 % angegeben. Im Gegenzug wird eine komplett entladene Zelle mit dem DoD von 100 % angegeben. Diese Angabe ist somit der Gegenteil des SoC. Der DoD lässt sich wie folgt bestimmen [61]:

$$\text{DoD} = 100\% - \text{SoC} \quad (2.8)$$

---

<sup>3</sup>Dabei gibt die Literatur unterschiedliche Angaben an

## 2.2. Grundlagen der elektrochemischen Impedanzspektroskopie

### 2.2.1. Anwendungsbereiche und Funktionsprinzip der EIS

#### Anwendungsbereiche

Die Impedanzspektroskopie ist ein bekanntes Messverfahren zur Untersuchung des frequenzabhängigen Impedanzverhaltens von unterschiedlichen Systemen [61]. Es findet sich ein breites Anwendungsfeld für diese Art der Untersuchung.

Eingesetzt wird die Impedanzspektroskopie, neben der Materialforschung, auch in der Medizintechnik [42]. Einen intensiven Einsatz findet die Impedanzspektroskopie in der Elektrochemie. Dabei wird diese Messmethode zur Analyse von galvanischen Zellen genutzt. Neben der Untersuchung von Brennstoffzellen [71] kann die Impedanzspektroskopie auch an Batterien durchgeführt werden. Mittels dieses Impedanzspektrums lassen sich Zustandsbestimmungen wie Alterung und Ladezustand der Batterie ermitteln und bewerten [68]. Auch können elektrochemische Vorgänge innerhalb der Batteriezelle untersucht und beobachtet werden [42]. Es ist also ein sehr vielfältiges Verfahren, dass heutzutage auch immer mehr Beachtung in der Forschung und der Diagnostik findet.

#### Funktionsprinzip

Zur Bestimmung des Impedanzspektrums wird das zu untersuchende System mit Hilfe eines periodischen Strom- bzw. Spannungssignals angeregt. Meist wird dazu ein sinusförmiges Anregesignal verwendet. Das zu untersuchende System antwortet bei einer Anregung mit Spannung mit einem, um den Phasenwinkel  $\varphi$  verschobenen Strom.

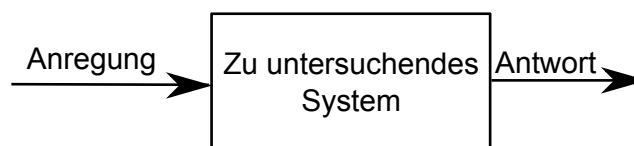


Abbildung 2.15.: Angeregtes System

Bei der Anregung mit einem Stromsignal wird die Antwort eine zum Anregesignal verschobene Spannung sein. Durch die Phasenverschiebung  $\Delta\varphi$  zwischen Anregung und Antwort sowie der Amplitudenhöhe der beiden Signale lässt sich nun die komplexe Impedanz des zu vermessenden Systems berechnen. Eine solche exemplarische Phasenverschiebung zwischen Anregung und Antwort zeigt die Abbildung 2.16.



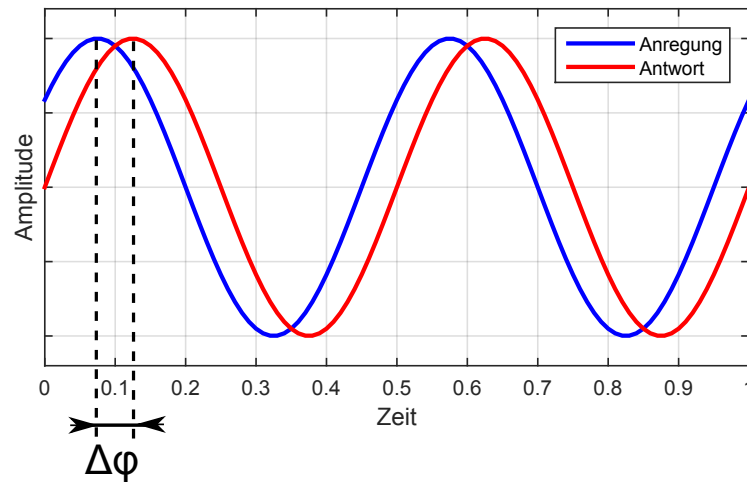


Abbildung 2.16.: Typische Phasenverschiebung zwischen Anregung und Antwort

Bei einem frequenzabhängigen System wird sich die Phasenverschiebung  $\Delta\varphi$  und die Amplitudenhöhe von Strom und Spannung in verschiedenen Frequenzbereichen ändern. Durch diese Änderung bei unterschiedlichen Frequenzen erhält man bei jeder Frequenz eine unterschiedliche komplexe Impedanz. Teilt man die komplexen Impedanzen, die bei verschiedenen Frequenzen gemessen wurden, in ihre Real- und Imaginärteile auf, so erhält man das Impedanzspektrum.

### 2.2.2. Mathematische Grundlagen zur Impedanzspektroskopie

Das Ziel der elektrochemischen Impedanzspektroskopie ist die Ermittlung des komplexen Innenwiderstandes  $\underline{Z}$  der zu vermessenden Batteriezelle bei verschiedenen Frequenzen. Als komplexer Widerstand  $\underline{Z}$  wird der Quotient der komplexen Spannung  $\underline{U}$  und des komplexen Stroms  $\underline{I}$  eines Zweipols bezeichnet.

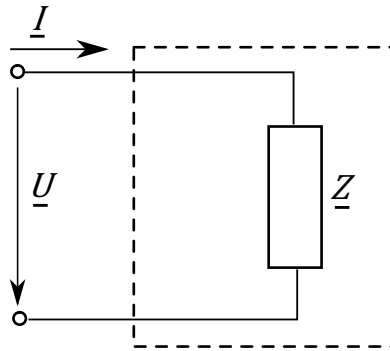


Abbildung 2.17.: Zweipol

Die Gleichung 2.9 zeigt den Zusammenhang zwischen komplexer Impedanz  $\underline{Z}$ , der komplexen Spannung  $\underline{U}$  und des komplexen Stroms  $\underline{I}$ .

$$\underline{Z}(\omega_0) = \frac{\underline{U}(\omega_0)}{\underline{I}(\omega_0)} \quad (2.9)$$

Die Kreisfrequenz  $\omega_0$  ist dabei wie folgt definiert:

$$\omega_0 = 2 \cdot \pi \cdot f_0 \quad (2.10)$$

$\underline{U}(\omega_0)$ ,  $\underline{I}(\omega_0)$  sowie  $\underline{Z}(\omega_0)$  sind somit kontinuierliche Funktionen der Frequenz  $f_0$ . Im Folgenden wird nun davon ausgegangen, dass es sich um eine komplexe Sinusspannung  $\underline{U}(\omega_0)$  mit der Phasenlage  $\varphi_u$  und um einen komplexen Strom  $\underline{I}(\omega_0)$  mit der Phasenlage  $\varphi_i$  handelt. Im eingeschwungenen Zustand des Systems lassen sich für Spannung und Strom die zeitabhängigen Werte wie folgt darstellen:

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_u) \quad (2.11)$$

$$i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_i) \quad (2.12)$$

Das Zeitsignal von Spannung und Strom ist hier in Abbildung 2.18 dargestellt. Dabei beschreibt der Phasenverschiebungswinkel  $\Delta\varphi$  die Differenz der Phasenlagen der Spannung und des Stromes.

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i \quad (2.13)$$

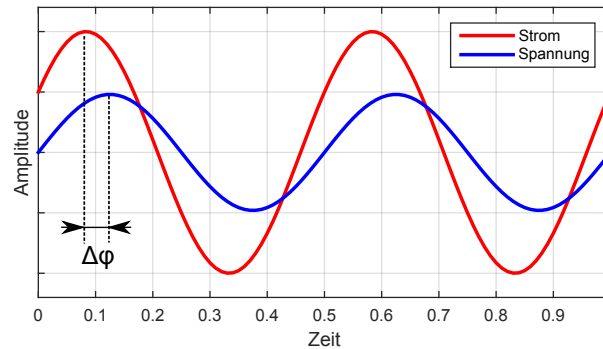


Abbildung 2.18.: Strom-Spannungs-Zeitsignale einer komplexen Impedanz

Durch die Tatsache, dass der Strom in der exemplarischen Abbildung 2.18 der Spannung voreilt, kann daraus geschlossen werden, dass es sich bei dem vorliegenden System um ein überwiegend kapazitives handelt. Bei einem überwiegend induktiven System wäre der umgekehrte Fall vorhanden, der Strom würde der Spannung nacheilen [18]. Da es sich bei der elektrochemischen Impedanzspektroskopie aber überwiegend um ein kapazitives System handelt, wird für die Beschreibung der mathematischen Grundlagen auch ein solches gewählt.

Um nun leichter rechnen zu können, werden die Spannung und der Strom, wie in der Wechselstromtechnik üblich, als komplexe Zahlenwerte dargestellt. Zunächst wird die Spannung in ihren Real- und Imaginärteil aufgespalten.

$$\operatorname{Re}\{U(\omega_0)\} = \hat{u} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_u) \quad (2.14)$$

$$\operatorname{Im}\{U(\omega_0)\} = \hat{u} \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_u) \quad (2.15)$$

Diese Aufspaltung lässt sich ebenfalls mit dem Strom durchführen.

$$\operatorname{Re}\{I(\omega_0)\} = \hat{i} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_i) \quad (2.16)$$

$$\operatorname{Im}\{I(\omega_0)\} = \hat{i} \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_i) \quad (2.17)$$

Durch das Zusammenfassen von Real- und Imaginärteil ergibt sich nun der komplexe Spannungs- bzw. der komplexe Stromwert.

$$\underline{u}(t) = \underbrace{\hat{u} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_u)}_{\text{Realteil}} + j \cdot \underbrace{\hat{u} \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_u)}_{\text{Imaginärteil}} \quad (2.18)$$

$$\underline{i}(t) = \underbrace{\hat{i} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_i)}_{\text{Realteil}} + j \cdot \underbrace{\hat{i} \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_i)}_{\text{Imaginärteil}} \quad (2.19)$$

Mit Hilfe der komplexen Zahlen lässt sich nun ein Zeigerdiagramm erstellen, welches die

Spannung und den Strom in der komplexen Zahlenebene darstellt. Die absolute Lage der Zeiger ist dabei nicht erforderlich, wichtig ist nur die Differenz des Phasenverschiebungswinkels  $\Delta\varphi$  in der Zahlenebene. In Abbildung 2.19 nimmt die Spannung die Lage des Nullphasenwinkels ein, d.h.  $\varphi_u = 0$

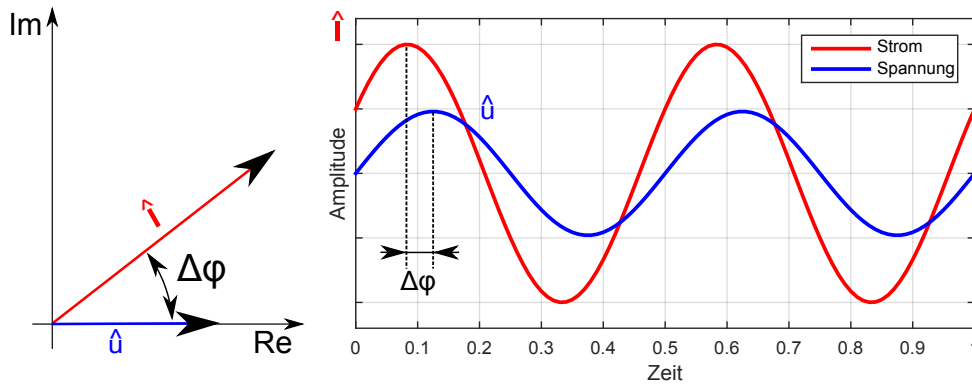


Abbildung 2.19.: Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm

Mittels der Eulerschen Beziehungen lässt sich die trigonometrische Form in die Exponentialform umrechnen. Dabei ergeben sich für die Spannung und für den Strom die folgenden Gleichungen:

$$\underline{U}(t) = \hat{u} \cdot e^{j\omega_0 t + \varphi_u} \quad (2.20)$$

$$\underline{I}(t) = \hat{i} \cdot e^{j\omega_0 t + \varphi_i} \quad (2.21)$$

Durch die Überführung der trigonometrischen Form in die Exponentialform lässt sich nun auf einfache Weise der komplexe Wechselstromwiderstand berechnen. Diese Definition entspricht der des Gleichstromwiderstandes mit der zusätzlichen Information der Phasenlage [18].

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U \cdot e^{j(\varphi_U)}}{I \cdot e^{j(\varphi_I)}} = \frac{U}{I} \cdot e^{j(\varphi_U - \varphi_I)} = |Z| \cdot e^{j\Delta\varphi_Z} \quad (2.22)$$

Dabei beschreibt  $|Z|$  den Betrag und  $\Delta\varphi_Z$  die Phase des komplexen Wechselstromwiderstands.

### 2.2.3. Darstellungsformen der komplexen Impedanz

Um die gemessenen Impedanzen darzustellen, gibt es zwei Darstellungsformen. Dies ist zum einen die Darstellung im Bode-Diagramm, welche häufig in der Elektrotechnik Einsatz findet. Zum anderen gibt es die Darstellungsform im Nyquist-Diagramm. Nachfolgend werden beide Darstellungsarten kurz vorgestellt.

#### Bode-Diagramm

Beim Bode-Diagramm werden der Betrag und die Phasen der Impedanz in Abhängigkeit der Frequenz dargestellt. Diese werden jeweils einzeln in unterschiedlichen Abbildungen dargestellt.

Typischerweise wird die Frequenzachse in der Bode-Form logarithmisch auf der Abszisse aufgetragen, dadurch lassen sich kleine Frequenzen wie auch große Frequenzen übersichtlich darstellen. Der Betrag der Impedanz wird linear aufgetragen. In Abbildung 2.20 ist der Impedanzverlauf einer  $\text{LiFePO}_4$ -Batteriezelle zu sehen.

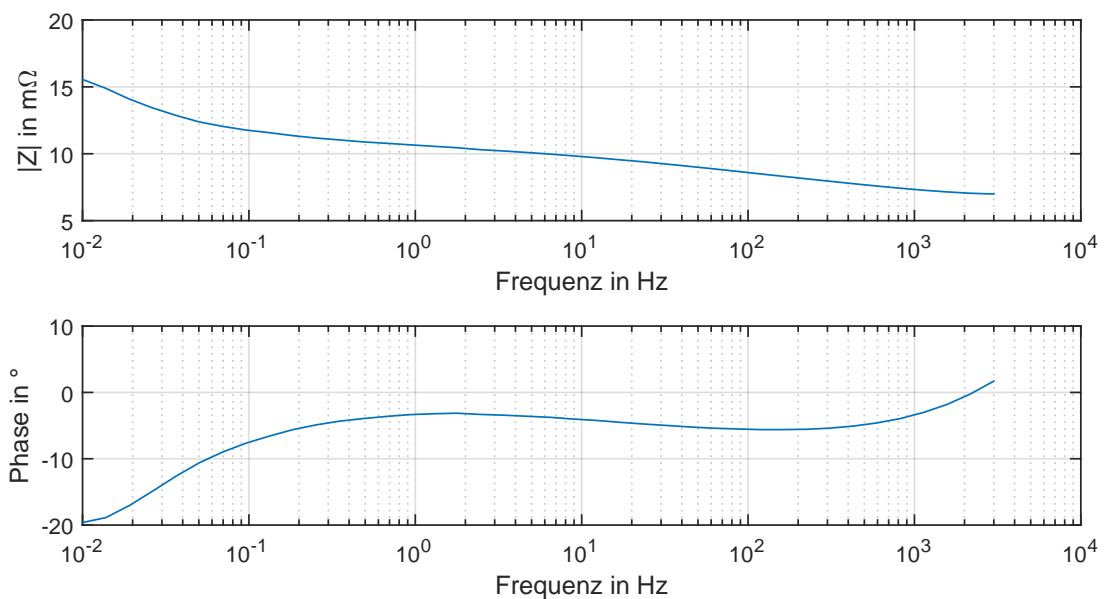


Abbildung 2.20.: Bode-Diagramm einer Impedanzspektroskopie einer  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle

### Nyquist-Diagramm

Eine in der Elektrochemie übliche Darstellungsform ist das Nyquist-Diagramm. Bei dieser Art der Darstellung wird die komplexe Impedanz in ihren Real- und Imaginärteil aufgespalten und jeweils auf einer Achse dargestellt. Meist wird im elektrochemischen Bereich die Ordinate umgekehrt dargestellt, da die meisten chemischen Systeme kapazitive Eigenschaften haben und somit das Diagramm einfacher zu lesen ist. Daher wird auch in dieser Arbeit diese Darstellungsform gewählt. Deshalb ist, wenn von einer Erhöhung der Impedanz gesprochen wird, von einem steigenden kapazitiven Anteil die Rede.

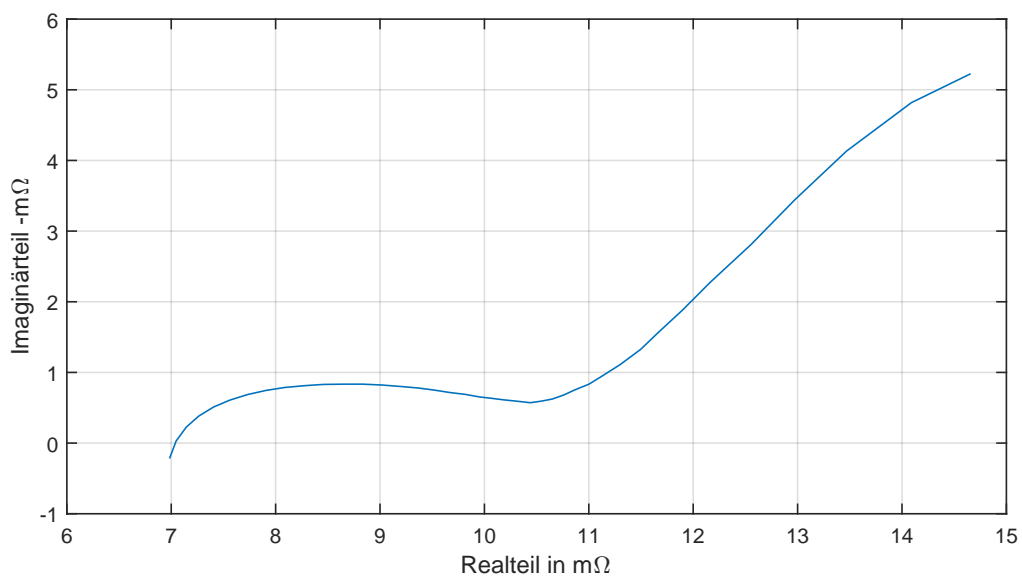


Abbildung 2.21.: Nyquist-Diagramm einer Impedanzspektroskopie

Ein großer Vorteil der Darstellung im Nyquist-Diagramm ist, dass man aus dem Impedanzspektrum schon sehr leicht in erster Näherung auf das Ersatzschaltbild des gemessenen Systems schließen kann. Darauf wird in Abschnitt 2.3 näher eingegangen.

Ein großer Nachteil dabei sind die fehlenden Frequenzangaben innerhalb des Diagramms. Meist werden einzelne Punkte innerhalb des Spektrums mit einer Frequenz beschriftet, um einen ungefähren Überblick über das Frequenzspektrum zu geben.

### 2.2.4. Informationen des Impedanzspektrums

Das charakteristische Impedanzspektrum einer Batteriezelle wird typischerweise im Frequenzbereich von wenigen mHz bis zu mehreren kHz aufgenommen. Dabei treten bei den verschiedenen Frequenzen unterschiedliche Reaktionen an der zu vermessenden Batteriezelle auf. Allgemein kann die elektrochemische Impedanzspektroskopie in vier Bereiche aufgeteilt werden, wie in Abbildung 2.22 zu sehen ist. Im ersten Bereich treten induktive Effekte der Batterie zum Vorschein. Diese treten erst bei Frequenzen im kHz Bereich auf, weshalb sie in der Literatur auch gern als Hochfrequenzwiderstand benannt werden [29]. Da die induktiven Anteile für die Bestimmung der SoC und SoH wenig interessant sind, findet dieser Bereich meist wenig Beachtung. Der Bereich II beschreibt den Ladungsaustausch zwischen den Elektroden und dem Elektrolyt. Im Bereich III lassen sich Aussagen über die Stofftransporte bzw. die Diffusion der Ladungsträger innerhalb des Elektrolyts treffen. Der Bereich IV zeigt die Diffusionen außerhalb des porösen Plattenmaterials. Da diese Messungen erst ab dem unteren mHz bis  $\mu$ Hz Bereich anfangen und somit die Messzeiten für diesen Bereich sehr hoch sind, wird dieser in der bekannten Literatur und auch in der vorliegenden Arbeit nicht weiter betrachtet.

Es werden die Bereiche I, II und III untersucht und im Folgenden näher erläutert.

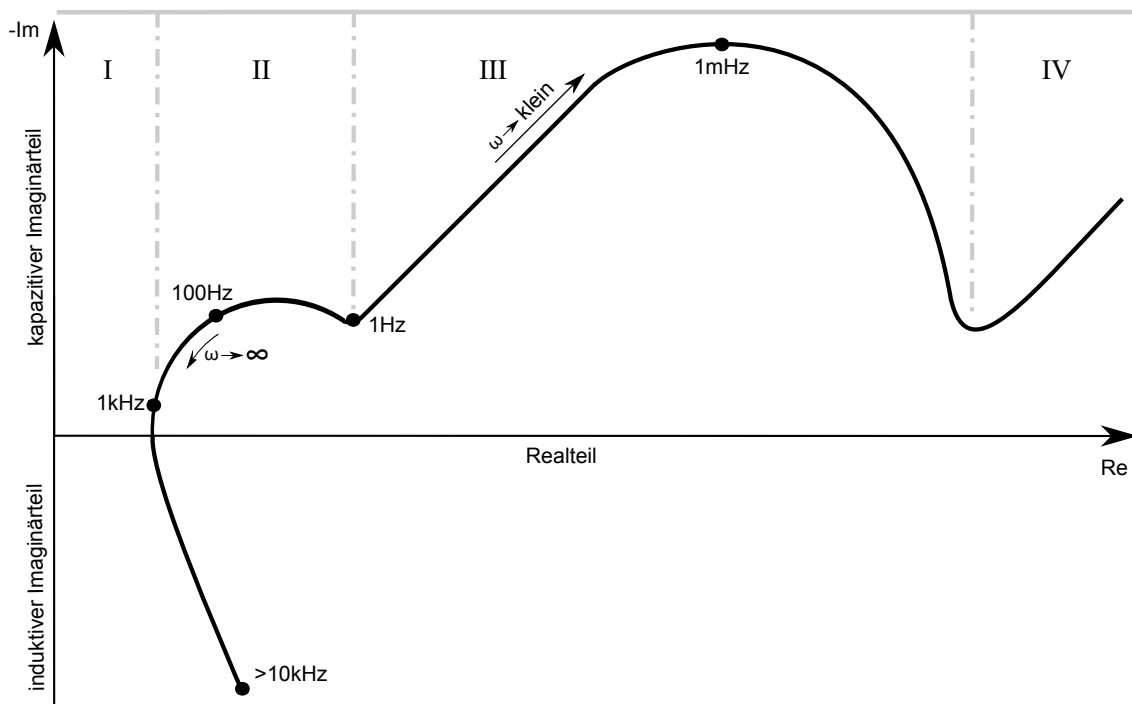


Abbildung 2.22.: Nyquist-Diagramm (nach [63])

### **Bereich I: Durchtrittspunkt und induktiver Bereich**

Der induktive Bereich tritt erst bei Messfrequenzen im kHz Bereich auf. Der Punkt, an dem das Verhalten vom kapazitiven in den induktiven Teil wechselt, nennt sich Durchtrittspunkt [61]. Dieser Durchtrittspunkt, an dem der Imaginärteil der komplexen Impedanz zu Null wird, entspricht dem Innenwiderstand der Zelle. Dieser setzt sich in erster Linie aus dem Widerstand der Stromleiter, des Aktivmaterials und des Elektrolyten zusammen. Er stellt also einen sehr interessanten Punkt für den Alterungszustand der Batteriezelle dar, da hier unter anderem Rückschlüsse auf die SEI-Deckschichten auf den Elektroden gezogen werden können. Der weitere induktive Anteil dagegen wird durch den geometrischen Aufbau der Batteriezelle beeinflusst und kann je nach Batterietyp stark variieren [57]. Konkrete Aussagen über den Zustand der Batteriezelle lassen sich durch den induktiven Anteil nicht machen, da dieser hauptsächlich durch die Induktivitäten der Messkabel beeinflusst wird. Dies ist der Grund, weshalb dieser Bereich in der Literatur wenig betrachtet wird und eine Messung über diesen Bereich nicht sinnvoll ist.

### **Bereich II: Ladungsaustausch zwischen den Elektroden und dem Elektrolyt**

Dieser Bereich erstreckt sich typischerweise von 1 Hz bis hin zum Durchtrittspunkt bei einigen kHz. Dieser Teil des Spektrums beschreibt den Ladungsaustausch zwischen den Elektroden und dem Elektrolyten. In diesem Bereich kann also eine Aussage über den Ladungsdurchtritt an der Doppelschicht, wie er im Abschnitt 2.1.2 beschrieben wurde, erfolgen.

### **Bereich III: Diffusionsast**

Im Diffusionsast sind Transportprozesse wie Diffusion und Ionenwanderung für das Verhalten der Batteriezelle verantwortlich [63] [61]. In diesem Bereich können Rückschlüsse auf den Ladezustand der Zelle gemacht werden. Dabei sind Messungen bis in den mHz Bereich notwendig, die aufgrund ihrer langen Periodendauer sehr zeitintensiv sind.



### 2.2.5. Anregung der Impedanzspektroskopie

Die Anregung des zu vermessenden Systems kann über verschiedenste Arten erfolgen. Der einfachste Fall ist die monofrequente Anregung, also der Anregung mit einer einzelnen Frequenz. In der Literatur werden aber auch andere Anregungsarten vorgestellt. So gibt es auch die Multi-Frequenz-Anregung, bei der das System mit mehreren Frequenzen gleichzeitig angeregt wird oder auch die Anregung mittels eines Frequenzsweeps. In der vorliegenden Arbeit wird aber ausschließlich mit einer monofrequenten Anregung gearbeitet, weshalb die anderen Anregearten hier nicht weiter betrachtet werden.

Bei der monofrequenten Anregung lassen sich grundsätzlich zwei verschiedene Arten unterscheiden. Dies ist zum einen die Anregung mit Hilfe eines Spannungssignals und zum anderen die Anregung mittels eines Stromsignals. Aus der Elektrochemie sind diese beiden Arten der Anregung als Untersuchungsmethode bereits bekannt. Dabei wird die Anregung mittels Spannung als potentiostatisches Untersuchungsverfahren und die Anregung mittels Strom als galvanostatisches Untersuchungsverfahren bezeichnet.

Die Messungen in dieser Arbeit sollen mit dem galvanostatischen Verfahren erfolgen. Ein großer Vorteil dieser Anregung ist, dass damit sehr einfach ein Arbeitspunkt für die Messung eingestellt werden kann. Dazu wird ein Gleichstrom angelegt, der von einem Wechselstrom überlagert wird. Die Einstellung eines Arbeitspunktes ist für die Vermessung der Impedanzspektroskopie wichtig, da es sonst zu Fehlmessungen kommen kann. Dies wird im Laufe dieser Arbeit nochmals näher betrachtet.

## 2.3. Batteriemodelle

Die Modellierung einer Batteriezelle ist sehr komplex. In der Literatur existieren viele Modellansätze, die das Verhalten einer Batteriezelle wiedergeben. Die verschiedenen Modellarten können dabei in drei Hauptkategorien eingeteilt werden.

Die erste Modellart ist das physikalisch-chemische Batteriemodell. In [60] werden diese physikalisch-chemischen Batteriemodelle als Modelle beschrieben, die auf mikroskopischer Ebene ablaufen, d.h. es werden reale Prozesse in der Zelle nachgebildet und versucht, das tatsächliche Zellverhalten zu simulieren. Man spricht dabei auch von Bottom-Up-Modellen. Eine weitere Methode ist das Modellieren mit elektrischen Ersatzschaltmodellen. Mittels dieser Ersatzschaltungen lässt sich das dynamische Verhalten einer Batteriezelle sehr gut annähern. Da diese Modelle aus elektronischen Bauteilen bestehen, sind diese weniger rechenaufwendig und somit gut für Simulationen geeignet.

Unter die dritte Modellkategorie lassen sich alle weiteren Modelle zusammenfassen. Diese sind zumeist rein mathematische Modelle.

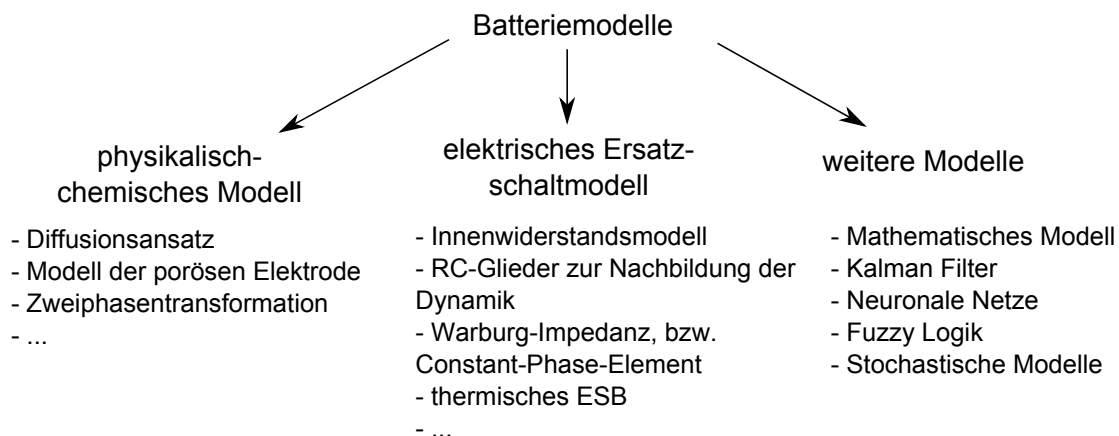


Abbildung 2.23.: Verschiedene Batteriemodelle (nach [16])

Da die Nachbildung einer vollständigen Batteriezelle mit all ihren Eigenschaften extrem komplex und rechenaufwendig wäre, muss das Modell nach dem Einsatzzweck ausgewählt werden. Es hat sich gezeigt, dass durch die Modellbildung mittels elektrischer Schaltungen die Charakteristik von Batteriezellen recht gut angenähert werden kann. Der Vorteil dabei ist, dass das komplexe Verhalten teilweise durch einfache Modelle mit relativ wenig Bauelementen näherungsweise abgebildet werden kann.

Bei der Modellierung einer Batteriezelle ist zwischen der Genauigkeit und dem Rechenaufwand zu unterscheiden. Soll die Genauigkeit erhöht werden, steigt gleichzeitig auch die Rechenzeit für das Modell. Für die Modellierung des dynamischen Verhaltens genügen meist wenige elektronische Bauelemente. Dabei löst man sich von der ursprünglichen Zellchemie und versucht, die Effekte auf diskrete Bauelemente zu übertragen. Das Thevenin-Theorem

[39] besagt, dass das Verhalten komplizierter linearer Netzwerke auch durch einfache Zweipole mit wenigen diskreten Elementen zurückzuführen ist [60]. Eingesetzt werden dabei üblicherweise Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten sowie Strom- und Spannungsquellen. Im Folgenden wird das Batteriemodell nach Randles<sup>4</sup> näher betrachtet. Dieses Modell wurde bereits in Abschnitt 2.1.2 als Ansatz für den elektrochemischen Aufbau verwendet.

### 2.3.1. Batteriemodell nach Randles

Randles unternahm 1947 theoretische Untersuchungen des Stromdurchgangs durch eine Elektrode [58]. Dabei entstand ein lineares Batteriemodell. Dieses Modell beschreibt schon die wesentlichen Merkmale, die für die Interpretation der elektrochemischen Impedanzspektroskopie wichtig sind.

Abbildung 2.24 zeigt hier das einfache Batteriemodell nach Randles. Dieses besteht aus einem parallel geschalteten RC-Glied mit einem in Reihe geschalteten Widerstand.

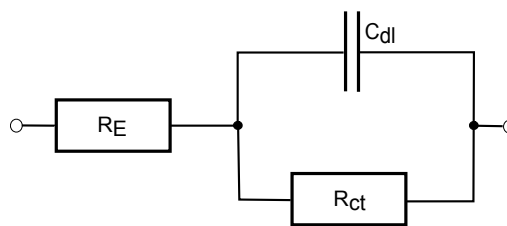


Abbildung 2.24.: Einfaches Batteriemodell nach Randles [58]

Dabei repräsentiert der vorgeschaltete Widerstand  $R_E$  den ohmschen Widerstand des Elektrolyten, den Übergang von den Elektroden zum Elektrolyt und den Widerstand zwischen Stromsammler und Aktivmaterial [68].

$R_{ct}$  ist der nichtlineare Durchtrittswiderstand zwischen Elektrode und Elektrolyt. Zusammen mit der Kapazität  $C_{dl}$ , die die Doppelschichtkapazität repräsentiert, bilden diese das RC-Glied im Batteriemodell.

---

<sup>4</sup>John Edward Brough Randles, Elektrochemiker

Die Impedanz des RC-Glieds errechnet sich wie folgt

$$\frac{1}{Z_{RC}} = \frac{1}{R_{ct}} + j\omega C_{dl} \quad (2.23)$$

$$\frac{1}{Z_{RC}} = \frac{1 + j\omega R_{ct} C_{dl}}{R_{ct}} \quad (2.24)$$

Die Gleichung 2.23 wird nun konjugiert komplex erweitert, um diese in ihren Real- und Imaginärteil aufspalten zu können.

$$\frac{1}{Z_{RC}} = \frac{(1 + j\omega R_{ct} C_{dl})(1 - j\omega R_{ct} C_{dl})}{R_{ct}(1 - j\omega R_{ct} C_{dl})} \quad (2.25)$$

$$\frac{1}{Z_{RC}} = \frac{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2}{R_{ct} - j\omega R_{ct}^2 C_{dl}} \quad (2.26)$$

$$Z_{RC} = \frac{R_{ct} - j\omega R_{ct}^2 C_{dl}}{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2} = \frac{R_{ct}}{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2} - j \cdot \frac{\omega R_{ct}^2 C_{dl}}{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2} \quad (2.27)$$

Die Gesamtimpedanz des einfachen Batteriemodells ergibt sich dann zu

$$Z_{ges} = R_E + Z_{RC} \quad (2.28)$$

$$Z_{ges} = R_E + \frac{R_{ct}}{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2} - j \cdot \frac{\omega R_{ct}^2 C_{dl}}{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2} \quad (2.29)$$

Die in Abbildung 2.25 zu sehende Impedanz  $Z$  des einfachen Batteriemodells nach Randles ist hier beispielhaft bei einer beliebigen Kreisfrequenz  $\omega$  und ihrem Phasenwinkel  $\alpha$  aufgezeichnet. Beim Abfahren des gesamten Frequenzbereichs entwickelt sich das Nyquist-Diagramm mit der charakteristischen RC-Ortskurve.

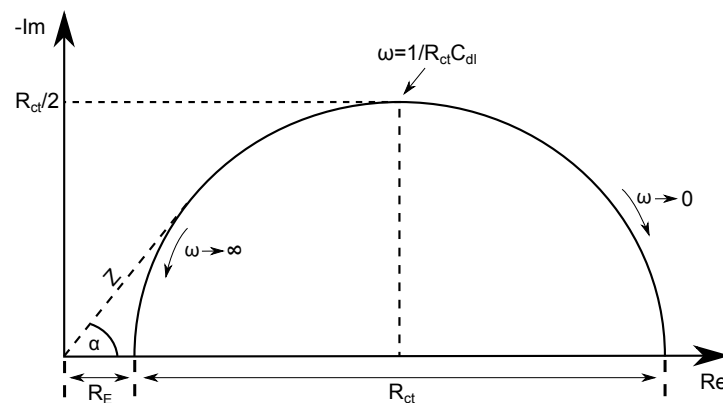


Abbildung 2.25.: Nyquist-Diagramm der Elektrodenimpedanz (nach [24])

Mit der Abbildung 2.25 und der Gleichung 2.29 können erste Abschätzungen für die Parameter der Widerstände  $R_E$  und  $R_{ct}$  für das einfache Batteriemodell erfolgen. In Abbildung 2.26 ist ein Vergleich zwischen einer realen Impedanzmessung und der Annäherung durch das einfache Batteriemodell zu sehen.

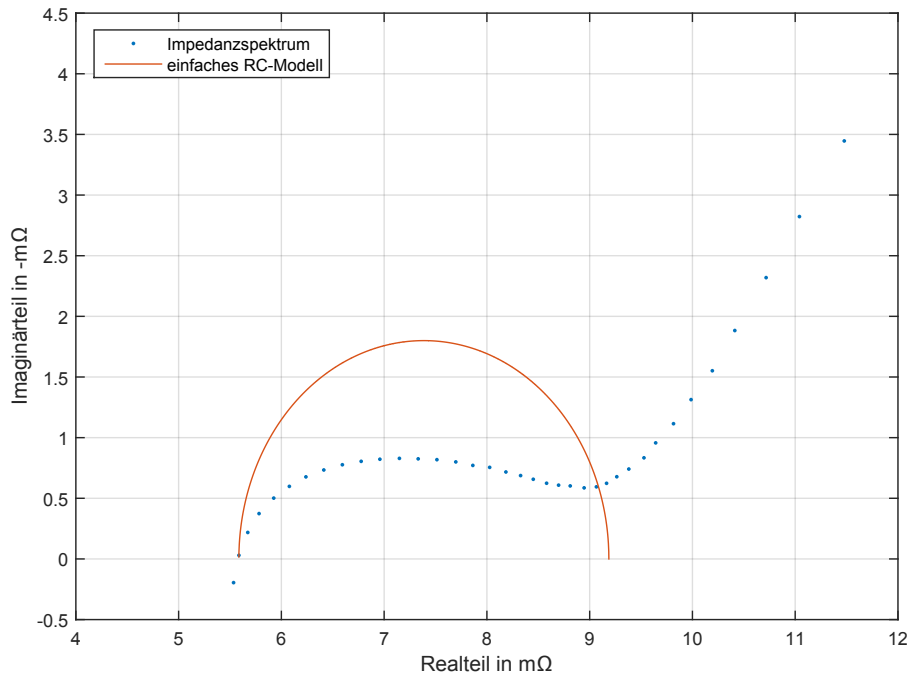


Abbildung 2.26.: Erste Abschätzung der Parameter für das Batteriemodell aus einem beispielhaften Impedanzspektrum

Die Werte für die Widerstände  $R_E$  und  $R_{ct}$  können aus der realen Impedanzmessung einfach abgeschätzt werden. Bestimmt wurden die Werte hier zu  $R_E = 5.58 \Omega$  und  $R_{ct} = 3.6 m\Omega$ . Zu erkennen ist aber auch, dass das einfache Batteriemodell nur eine erste Annäherung an das Impedanzspektrum geben kann. Eine Näherung ist lediglich am Durchtrittspunkt an der Ordinate und dem Halbkreis, der den Ladungsaustausch zwischen den Elektroden und dem Elektrolyt beschreibt, möglich. Eine Annäherung an den Diffusionsast ist mit dem einfachen Batteriemodell nicht möglich. Für eine genauere Annäherung an den Diffusionsast ist eine Erweiterung des Batteriemodells um ein RC-Glied notwendig.

### Erweitertes Batteriemodell

Durch das Hinzufügen eines weiteren RC-Glieds, lassen sich die dynamischen Vorgänge der zu modellierenden Batteriezelle näher beschreiben. So lässt sich die Annäherung an den Diffusionsast durch ein weiteres RC-Glied erreichen.

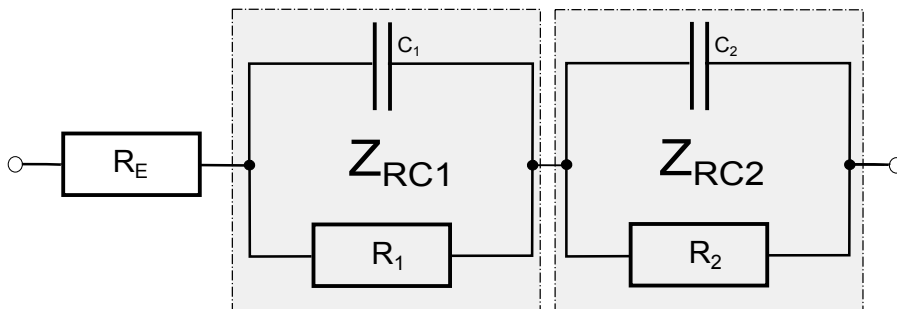


Abbildung 2.27.: Erweitertes Batteriemodell nach Randles [58]

Um das Verhalten der Schaltung bezüglich ihrer Impedanz zu untersuchen, wird diese auch wieder in ihre Real- und Imaginärteile aufgespalten. Die Schaltung besteht dabei aus zwei in Reihe geschalteten Impedanzen und dem reellen Widerstand  $R_E$ .

Für die Impedanz der RC-Glieder kann Gleichung 2.27 verwendet werden.

$$Z_{RC1} = \frac{R_1 - j\omega R_1^2 C_1}{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} = \frac{R_1}{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} - j \cdot \frac{\omega R_1^2 C_1}{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} \quad (2.30)$$

$$Z_{RC2} = \frac{R_2 - j\omega R_2^2 C_2}{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2} = \frac{R_2}{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2} - j \cdot \frac{\omega R_2^2 C_2}{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2} \quad (2.31)$$

Die Gesamtimpedanz des erweiterten Batteriemodells ergibt sich zu

$$Z_{ges} = R_E + Z_1 + Z_2 \quad (2.32)$$

$$Z_{ges} = R_E + \frac{R_1}{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} + \frac{R_2}{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2} - j \left( \frac{\omega R_1^2 C_1}{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} + \frac{\omega R_2^2 C_2}{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2} \right) \quad (2.33)$$

Es ergeben sich im Nyquist-Diagramm zwei Halbkreise, die ineinander übergehen. Dadurch erhält man die weitere Annäherung an den Diffusionsast, die in Abbildung 2.28 zu sehen ist.

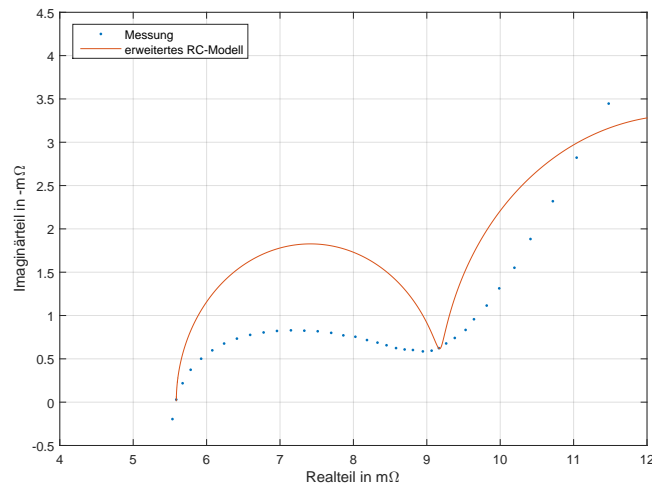


Abbildung 2.28.: Nyquist-Diagramm des erweiterten Randles Batteriemodells

Wie schon am Anfang des Abschnitts erklärt, ist bei der Modellierung eines Batteriemodells immer zwischen der Genauigkeit und des Rechenaufwands zu unterscheiden. Dadurch ist eine genauere Annäherung an das reale Impedanzverhalten mit einer steigenden Anzahl der RC-Glieder zu erreichen. Dies bedeutet aber auch ein rechnerisch aufwendigeres Modell. In [16] werden verschiedene Batteriemodelle mit mehreren RC-Gliedern vorgestellt. In Abbildung 2.29 ist der Unterschied zwischen einem Batteriemodell mit zwei RC-Gliedern und dem Modell mit vier RC-Gliedern dargestellt. Deutlich ist dabei die bessere Annäherung an das Impedanzspektrum zu erkennen.

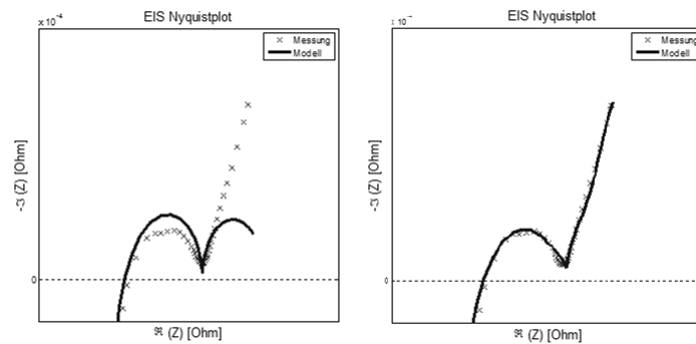


Abbildung 2.29.: Links: Batteriemodell mit zwei RC-Gliedern; Rechts: Batteriemodell mit vier RC-Gliedern (ent. aus [16])

Allerdings stellt sich die Parametrisierung der einzelnen RC-Glieder als sehr aufwendig dar. In [16] sowie in [28] werden Verfahren vorgestellt, die sich eigens mit der Parametrisierung der Batteriemodelle beschäftigt.

### 2.3.2. Optimiertes Batteriemodell

Da die Parametrisierung für die Annäherung an die Impedanzspektroskopie mittels RC-Gliedern sehr aufwendig ist, wird hier noch ein optimiertes Batteriemodell vorgestellt, bei dem auf die eine Bindung an reale Bauelemente verzichtet wird. Dabei handelt es sich um die, aus dem einfachen Batteriemodell errechnete Gleichung 2.29 und der in Abschnitt 2.1.2 vorgestellten Beschreibung der Warburg-Impedanz.

$$Z_{ges} = R_E + \frac{R_{ct}}{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2} + \sigma(\omega)^{-1/2} - j \left( \frac{\omega R_{ct}^2 C_{dl}}{1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2} + \sigma(\omega)^{-1/2} \right) \quad (2.34)$$

Mit Hilfe dieses optimierten Batteriemodells lässt sich eine sehr gute Näherung an die reale Messung der Impedanzspektroskopie erreichen.

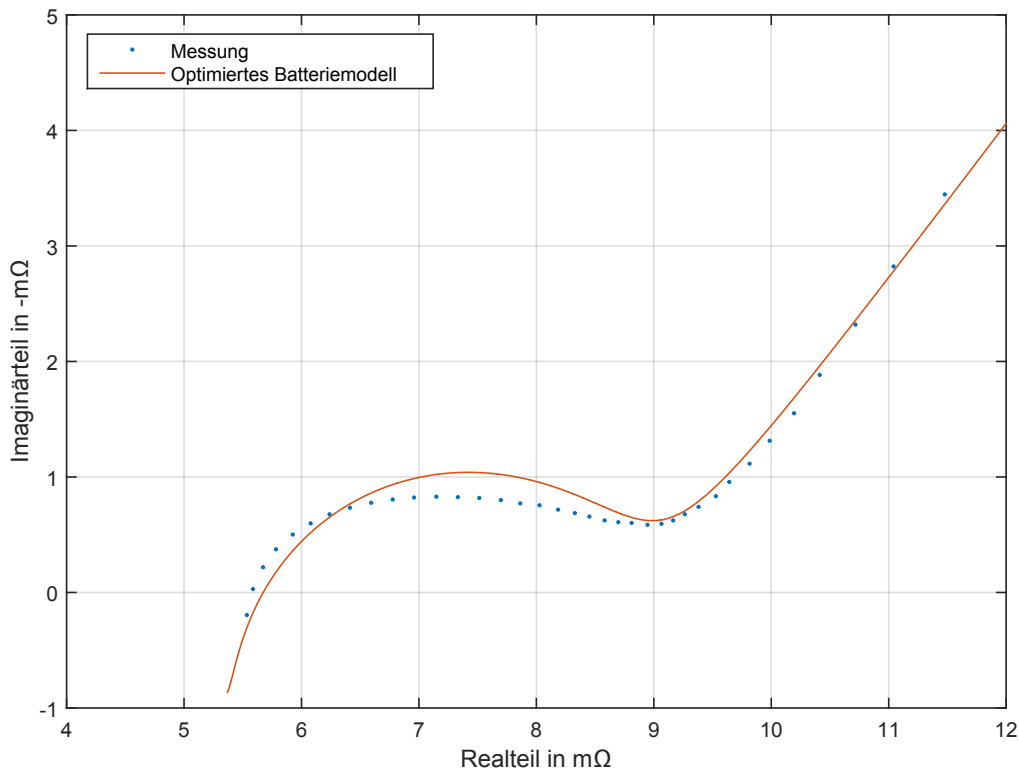


Abbildung 2.30.: Vergleich zwischen einem gemessenen Impedanzspektrum und dem vorgestellten optimierten Batteriemodell

Anhand dieses optimierten Batteriemodells lassen sich nun Untersuchungen durchführen, wie sich Alterungseffekte der Batteriezelle auf das Impedanzspektrum auswirken.



### 2.3.3. Alterung am Batteriemodell

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie sich das Impedanzspektrum verändert, wenn die Batteriezelle altert. Dies kann nun mit der ermittelten Gleichung 2.34 leicht untersucht werden. In [68] wird angegeben, dass sich bei der Alterung von Batteriezellen hauptsächlich die Leitfähigkeit des Aktivmaterials verschlechtert. Zudem nimmt die Speicherefähigkeit der Doppelschichtkapazität ab.

Dies bedeutet, dass sich im Batteriemodell die folgenden Bauteile verändern:

Tabelle 2.2.: Übersicht der Bauteiländerungen bei Alterung

Effekt durch Alterung	Auswirkung auf	Werteveränderung
Leitfähigkeit Aktivmaterial sinkt	$R_E$	Widerstand steigt
Übergang zw. Elektrolyten und Elektrode steigt	$R_{ct}$	Widerstand steigt
Doppelschichtkapazität sinkt	$C_{dl}$	Kapazität sinkt

Die obenstehende Tabelle gibt nur ein kleinen Teil der tatsächlichen Effekte der Batteriealterung wieder. In [26] werden eine großen Anzahl von verschiedenen Effekten vorgestellt, die zu einer Alterung der Batteriezelle führen. Die hier vorgestellten Effekte haben allerdings den größten Einfluss und sind für eine Untersuchung des Impedanzspektrums bei der Batteriealterung ausreichend.

Untersuchungen aus [60] haben ergeben, dass sich für den Widerstand  $R_E$  eine Änderung von ca. 10 % und für  $R_{ct}$  eine Änderung von ca. 12 % ergeben. Die Doppelschichtkapazität  $C_{dl}$  verändert mit einem Kapazitätsverlust von ca. 11 %. Diese Werte wurden nach 3.000 Zyklen mit einer Stromstärke von 5C, einer  $\text{LiFePO}_4$  Zelle entnommen. Angaben, bei welcher Temperatur die Zyklen gefahren wurden, wurden dabei nicht gemacht.

Diese Ergebnisse können nun mit Gleichung 2.34 zu den Nominalwerten verglichen werden. Abbildung 2.31 zeigt die Änderungen des Impedanzspektrums, welches mit Hilfe des optimierten Batteriemodells ermittelt wurde.

Zu sehen ist, dass sich mit den veränderten Werten die komplette Impedanzkurve nach rechts verschiebt. Dies resultiert aus den angestiegenen Widerständen  $R_E$  und  $R_{ct}$ . Am Durchtrittspunkt ist die 10 %ige Widerstandsänderung von  $R_E$  gut zu erkennen. Die Veränderung von  $R_{ct}$  und  $C_{dl}$  wirken sich auf den Halbkreis aus. Ein direktes Ablesen der Bauteilwerte ist hier allerdings nicht ohne Weiteres möglich, da hier bereits der Einfluss der Warburg-Impedanz vorliegt.

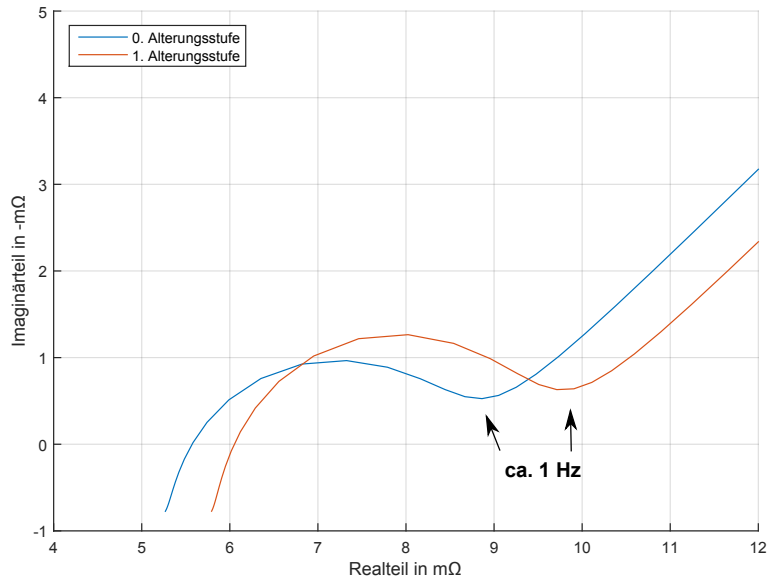


Abbildung 2.31.: Alterung am Batteriemodell

Ein möglicher Indikator für eine fortgeschrittene Alterung der Batteriezelle kann der Realteil des Wendepunkts zwischen RC-Halbkreis und der Geraden der Warburg-Impedanz sein. An diesem Punkt unterscheiden sich die beiden Alterungsstufen der Batteriezelle am meisten. In der Literatur wird für diesen Punkt meist eine Anregefrequenz von ca. 1 Hz angegeben. Diese Ergebnisse müssen später in der Konzeption des Messsystems beachtet werden, um den Alterungszustand mit Hilfe der Batteriesensoren zu bestimmen.

## 2.4. Reale Batteriealterung

Um das zuvor erstellte Batteriealterungsmodell zu verifizieren und die Auswirkung der Alterung an realen Batteriezellen zu ermitteln, wurde eine  $\text{LiFePO}_4$ -Batteriezelle künstlich gealtert und in regelmäßigen Abständen vermessen. Dabei konnte das theoretische Batteriealterungsmodell bestätigt werden. Die Abbildung 2.32 zeigt diese künstliche Alterung. Es ist jeweils die initiale Messung und die letzte Messung nach sieben Wochen künstlicher Alterung zu sehen. Sehr gut erkennbar ist, dass wie bei dem Batteriealterungsmodell, die komplette Impedanzkurve nach rechts verschoben wird. Ein besonders großer Unterschied im Realteil ist bei ca. 1 Hz zu sehen. Es lässt sich also auch dieser Punkt als guter Alterungsindikator bestätigen.

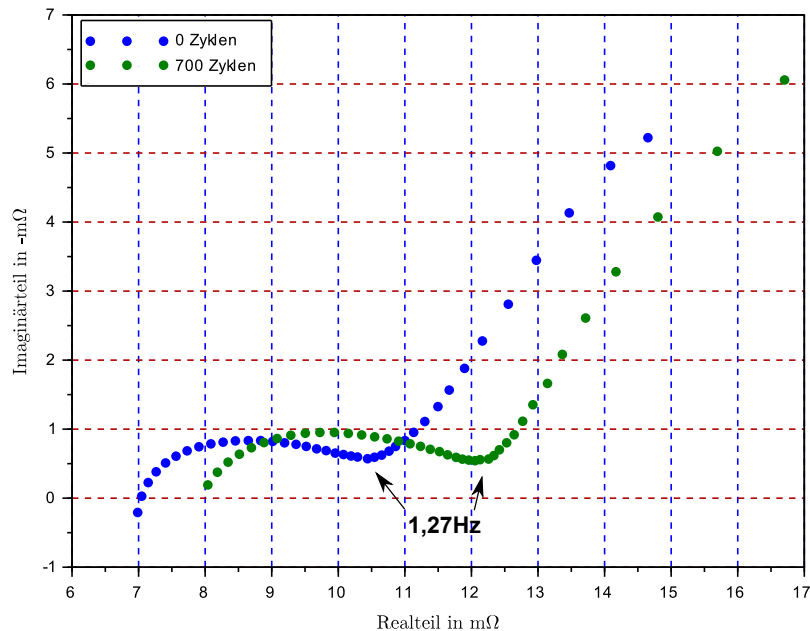


Abbildung 2.32.: Künstliche Alterung einer  $\text{LiFePO}_4$  Zelle bei zwei verschiedenen Alterungszuständen

Es zeigt sich, dass sich mit dem zuvor entwickelten theoretischen Batteriemodell sehr gut das reale Verhalten des Impedanzspektrums beschreiben lässt. Dieses Batteriemodell kann nun genutzt werden, um die Spezifikationen einer möglichen Neukonzeptionierung des Messsystems vorzunehmen.

Ausführlich wird die durchgeführte künstliche Batteriealterung im Anhang D beschrieben.

## 3. Analyse und Neukonzeption des Messsystems

In diesem Kapitel wird eine Analyse des bestehenden Hard- und Softwaresystems durchgeführt. Dabei muss untersucht werden, inwieweit die aktuell vorhandene Hardware für die Untersuchung der funksynchronisierten Impedanzspektroskopie geeignet ist. Dazu müssen die Mindestanforderungen der Impedanzspektroskopie erarbeitet und mit dem vorhandenen Hard- und Softwaresystem verglichen werden. Daraus sollen dann Lösungskonzepte und mögliche Hard- und Softwareänderungen am bestehenden Messsystem entstehen.

### 3.1. Aktueller Stand des Messsystems

Der aktuelle Stand des Messsystems besteht aus den Zellsensoren der Klasse 3 und einem Batteriesteuergerät, welches in Abbildung 3.1 zu sehen ist.



Abbildung 3.1.: Batteriesteuergerät mit CC1101-Transceiver Platine und Zellsensor der Klasse 3 mit hochauflösender AD-Wandler Erweiterungsplatine

Deren Hardware wird im Folgenden kurz vorgestellt um zu prüfen, ob diese die messtechnischen Anforderungen an die funksynchronisierte Impedanzspektroskopie erfüllen kann. Für weitere Einzelheiten der Hardware sei an dieser Stelle auf die bisherigen Arbeiten der Arbeitsgruppe verwiesen, die sich mit der Entwicklung der Zellsensoren und des Batteriesteuergeräts beschäftigt haben [48],[62],[14].

### 3.1.1. Zellsensor

Innerhalb der Arbeitsgruppe wurden schon mehrere Zellsensoren unterschiedlicher Klassen entwickelt. Alle haben dabei die Aufgabe, den Zellzustand zu ermitteln. Dabei wurden verschiedene Verfahren der Messungen angewendet. Auf die Klassen 1 und 2 sei an dieser Stelle nur hingewiesen, diese werden in dieser Arbeit nicht weiter diskutiert. Der in dieser Arbeit verwendete Zellsensor ist aus der Klasse 3, welche hier kurz vorgestellt wird.

Die Hauptmerkmale eines Zellsensors der Klasse 3 sind zum einen eine bidirektionale drahtlose Kommunikation zwischen Zellsensor und Batteriesteuergerät. Diese Kommunikation wird mittels eines aktiven Transceivers im 434 MHz ISM-Band realisiert. Zum anderen besitzt dieser über einen sehr energiesparenden Schlafmodus, welcher durch ein Funksignal des Batteriesteuergeräts unterbrochen werden kann.

Die messtechnischen Aufgaben des Zellsensors sind recht einfach und übersichtlich. Seine Hauptaufgaben sind die Messung der Spannung sowie der Temperatur der Zelle und der Balancierung der Zellspannung. Dabei handelt es sich um eine passive Balancierung, welche durch das Hinzuschalten von Widerständen realisiert wird. Dadurch soll die Zellspannung an die Spannung anderer Zellen innerhalb eines Batterieblocks angepasst werden, um diese vor einer Über- bzw. Tiefenentladung zu schützen. In der Arbeit [62] wurde für die Sensoren der Klasse 3 eine neue Messmethode entwickelt, mit der zeitlich hoch synchronisierte Spannungsmessungen möglich wurden. Mit der sog. Burstmessung sind Messungen von bis zu mehreren kSPS möglich. Diese zeitlich hoch synchronisierte Messmethode bildete die Grundlage für die Messung der elektrochemischen Impedanzspektroskopie mittels der Zellsensoren. Implementiert und getestet wurde die Impedanzmessung mit den Zellsensoren der Klasse 3 erstmalig in der Arbeit [48]. Darin wurde nachgewiesen, dass es möglich ist, mit der entwickelten Burstmessung Phasenverschiebungen zwischen Spannung und Strom zu messen und daraus die komplexen Impedanzen zu berechnen. Allerdings konnten noch keine Messungen im Impedanzbereich einer Batteriezelle durchgeführt werden.

An dieser Stelle greift nun diese Arbeit ein, um die Vermessung der Impedanzspektroskopie an den Zellen mit den Sensoren der Klasse 3 zu realisieren. Bisher beschäftigten sich drei verschiedene Arbeiten mit der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Zellsensors der Klasse 3. Im Folgenden wird der Zellsensor der letzten Entwicklungsstufe analysiert.

### Hardwareanalyse

In der letzten Arbeit [48] entstand erstmalig ein Zellsensor der Klasse 3, der für die hochgenaue Messung der Zellspannung einen externen AD-Wandler nutzt. Dabei handelt es sich um einen 24-Bit Delta-Sigma Wandler (Texas Instruments ADS1291) der auf einem Erweiterungsmodul (Abbildung 3.2) angebracht wurde.

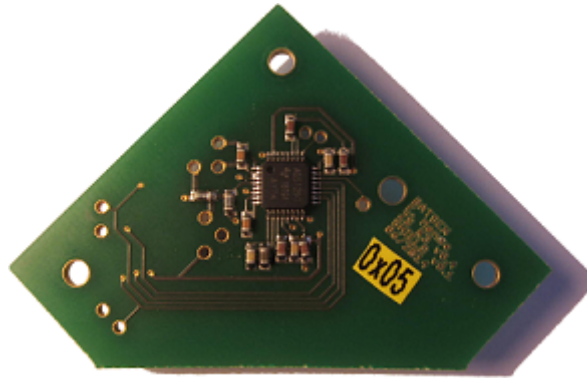


Abbildung 3.2.: AD-Wandler Erweiterungsmodul (ent. aus [48])

Der Zellsensor selbst wurde durch ein Redesign erneuert. Dabei kam ein neuer Mikrocontroller (Texas Instruments CC430F5137) zum Einsatz, der bereits einen aktiven Transceiver integriert hat. Somit konnte Platz auf dem Zellsensor eingespart werden, da weniger Bauteile eingesetzt werden mussten. Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung des neuen Mikrocontrollers liegt bei seiner größeren Speicherkapazität. Diese hat sich im Vergleich zum vorhergehenden Controller von 2 kByte auf 4 kByte verdoppelt. Der Controller lässt sich bis zu einer max. Taktfrequenz von 20 MHz betreiben. Er kann somit um 4 MHz schneller getaktet werden als der vorher verwendete Mikrocontroller (Texas Instruments MSP430F235). Die übrige Hardware wurde bei diesem Redesign nicht verändert, wird im Folgenden aber kurz erklärt. Die Spannungsversorgung des Zellsensors wird über einen Step-Up/Down-Konverter (Texas Instruments TPS61201) auf 3,3 V gebracht. Dadurch wird die gesamte Elektronik des Sensors versorgt. Sämtliche Komponenten wurden somit auf 3,3 V ausgelegt. Des Weiteren besitzt der Zellsensor eine passive Wake-Up Schaltung. Mittels dieser Schaltung ist es möglich, den Zellsensor durch ein Funksignal aus einem energiesparenden Ruhezustand in den normalen Betriebsmodus zu bringen. Dies hat den Vorteil, dass der Zellsensor, wenn dieser keine Messungen durchführen soll, in einen sehr energiesparenden Ruhezustand versetzt werden kann. Nähere Details dazu sind in der Arbeit [14] zu finden. Da für die Wake-Up Schaltung sowie für den aktiven Transceiver dieselbe Antenne genutzt wird, kommt ein Antennenumschalter (Analog Devices ADG918) zum Einsatz, der den Antennenpfad umschalten kann. Die Temperaturüberwachung der Zelle erfolgt über einen, auf der Sensorplatine aufbrachten Temperatursensor (TMP102). Dieser besitzt eine Warnfunktion, die automatisch bei der Überschreitung einer einstellbaren Temperatur ein Signal

an den Mikrocontroller schickt, der darauf reagieren kann. Die passive Ladungsbalancierung wird durch schaltbare Strompfade realisiert. Dabei können durch MOSFET-Schalter zwei Strompfade mit jeweils  $20\Omega$  Widerständen zu- bzw. abgeschaltet werden, über die überschüssige Ladung der Zelle abgeführt wird. Das Blockschaltbild in Abbildung 3.3 zeigt die eingesetzten Komponenten und deren Verbindungen auf dem Zellsensor der Klasse 3.

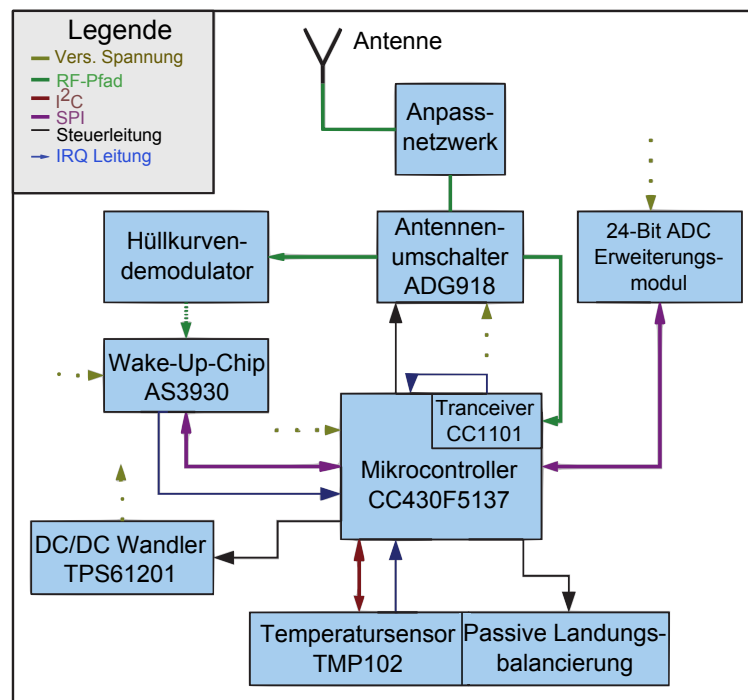


Abbildung 3.3.: Blockschaltbild des Zellsensors v0.4 und deren Verbindungen der Sensor-klasse 3 (nach [48])

- Mikrocontroller Texas Instruments CC430F5137 mit integriertem Transceiver
- 24 Bit AD-Wandler Erweiterungsmodul Texas Instruments ADS1291
- 3,3 V Spannungsversorgung Texas Instruments TPS61201 Step Up/Down-Konverter
- Wake-Up Receiver AMS AS3930
- Antennenumschalter Analog Devices ADG918
- Passive Ladungsbalancierung mittels zwei schaltbarer Strompfade
- Temperaturmessung mit Warnfunktion Texas Instruments TMP102

## Softwareanalyse

In der Softwareanalyse des Zellsensors werden die bisher möglichen Funktionen des Zellsensors betrachtet. Diese sind die Spannungsaufnahme der Zellspannung, die Temperaturüberwachung der Zelle sowie die Balancierung der Zellladung. Diese Funktionen sind noch aus der Vorgängerarbeit unverändert geblieben, weshalb für nähere Details der Softwarefunktionen auf die Arbeit [62] bzw. [14] verwiesen wird. Nähere Beachtung findet hier die Möglichkeit der funksynchronisierten Messung der Zellspannung über den Sensor und der Speicherung der aufgenommenen Spannungswerten.

Die Spannungsmessungen für die funksynchronisierten Messungen finden mittels des auf dem Erweiterungsmodul befindlichen 24 Bit AD-Wandlers (Texas Instruments ADS1291) statt. In der Arbeit [48] wurde festgestellt, dass durch dieses Erweiterungsmodul eine maximale Messrate von bis 350 Hz realisiert werden kann, ohne die geforderte Messgenauigkeit von  $10 \mu\text{V}$  zu unterschreiten. Bei dieser Messrate erreicht der AD-Wandler noch ein ENOB<sup>1</sup> von 18 Bit. Für die Minimierung des Speicherbedarfs wurde entschieden, die gemessenen Speicherwerte nicht in voller Auflösung abzuspeichern, sondern lediglich in einer Auflösung von 16 Bit. Dabei konnte noch ein zu messender Spannungsbereich von 2,8 V bis 3,9 V abgedeckt werden. Durch diese Reduzierung des Speicherbedarfs konnte eine Aufnahme von 1.900 Messwerten auf dem Zellsensor realisiert werden.

## Zusammenfassung der Zellsensoranalyse

Der Zellsensor ist aktuell in der Lage, funksynchronisierte Messungen bis zu einer maximalen Messrate von 350 Hz durchzuführen. Dabei kann er im Spannungsbereich von 2,8 V bis 3,9 V eine maximale Anzahl von 1.900 Messwerten mit einer Auflösung von 16 Bit aufnehmen. Es konnte in der Arbeit [48] auch nachgewiesen werden, dass es möglich ist, über die funksynchronisierte Messmethode ein Impedanzspektrum zu messen. Messungen konnten dabei aber lediglich an einer Testimpedanz durchgeführt werden, die außerhalb des zu erwartenden Impedanzbereichs einer realen Batteriezelle lag. Ob es mit der funksynchronisierten Messmethode auch möglich ist, das Impedanzspektrum einer Batteriezelle zu vermessen, muss in dieser Arbeit untersucht werden.

---

<sup>1</sup>effektive Anzahl von Bits (engl. effective number of bits)



### 3.1.2. Batteriesteuergerät

Als Batteriesteuergerät für Zellsensoren der Klasse 3 wurde ursprünglich ein Evaluations-Board (Olimex MSP430-169STK) mit einem energiesparenden Controller des Typs MSP430F169 eingesetzt (Abbildung 3.4). Dieses verfügt über ein RS232 Interface, eine externe SPI-Schnittstelle sowie ein 16x2 LCD Display. Über die externe SPI-Schnittstelle wurde ein Transceiver-Board angesteuert, welches auf der Basis eines Texas Instruments CC1101 Transceiver die Kommunikationsschnittstelle mit den Zellsensoren herstellt. Im Projektverlauf hat sich allerdings herausgestellt, dass dieses Evaluations-Board für die Aufgaben des Batteriesteuergeräts nicht ausreichend ist.

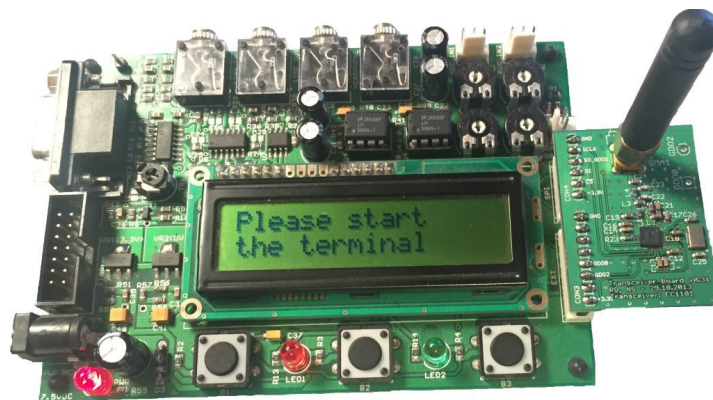


Abbildung 3.4.: Batteriesteuergerät für Zellsensoren der Klasse 3 auf Basis eines Evaluations-Board (Olimex MSP430-169STK)

So ist die Rechenleistung des mit 8 MHz getakteten Mikrocontrollers zu langsam um die Steuerung von mehreren Zellsensoren sowie der Signalverarbeitung der Daten zu übernehmen. Hauptnachteil ist aber die fehlende Möglichkeit zur Implementierung einer Strommessung, welche für die Messung der Impedanzspektroskopie dringend erforderlich ist. Grund hierfür ist, dass das Board keine weiteren Ein- bzw. Ausgänge mehr zu Verfügung stellt, an denen eine Strommessung realisiert werden könnte. Daher wurde entschieden, ein leistungsstärkeres Batteriesteuergerät zu entwickeln, welches über mehr Ein- bzw. Ausgänge verfügt. Da diese Neuentwicklung ebenfalls Bestandteil dieser Arbeit ist, wird auf eine nähere Hard- und Softwareanalyse des bisherigen Steuergeräts an dieser Stelle verzichtet. Für nähere Details des bisherigen Batteriesteuergerätes sei auf die Arbeiten [62] sowie [14] verwiesen.

## 3.2. Analyse der messtechnischen Anforderungen

In diesem Abschnitt sollen die messtechnischen Mindestanforderungen für die EIS-Messung ermittelt werden. Diese ergeben sich vor allem aus den gewünschten Anforderungen der Messgenauigkeit, des zu messenden Frequenz- oder auch des Impedanzbereichs. Um einen Überblick, der wichtigsten Parametern zu bekommen, werden zunächst kommerziell erhältliche EIS-Labormessgeräte auf ihr Leistungsspektrum hin untersucht. Dies soll einen ersten Aufschluss darüber geben, welche Parameter für die Messung der EIS wichtig sind und in welchem Bereich diese liegen.

### 3.2.1. Analyse kommerzieller EIS-Labormessgeräte

Für die Analyse kommerziell erhältlicher EIS-Labormessgeräte werden die beiden Geräte von FuelCon und Digatron auf ihre Parameter hin untersucht. Beide sind eigenständige Labormessgeräte mit eigener Anrege- und Messelektronik. In Tabelle 3.1 werden die wichtigsten Parameter, die für eine EIS-Messung nötig sind, aufgelistet.

Tabelle 3.1.: Übersicht kommerzieller EIS-Meter

	FuelCon	Digatron
Messfrequenzbereich	0,2 mHz - 100 kHz	1 mHz - 10 kHz
Impedanzbereich	$5 \mu\Omega - 15 \Omega$	$300 \mu\Omega - 3 \Omega$
Phasengenauigkeit	$1^\circ$	$1^\circ$
Impedanzgenauigkeit	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$

Anhand dieser Tabelle kann ein erster Bereich definiert werden indem sich die Parameter für die EIS-Messung befinden sollen.

### 3.2.2. Messfrequenzbereich

Kommerzielle Geräte verfügen über einen sehr breiten Frequenzbereich. Typischerweise liegt der Frequenzbereich bei der Impedanzspektroskopie von Batteriezellen im Bereich von einigen kHz bis hin zu wenigen  $\mu\text{Hz}$  [42]. Um eine Aussage über den SoH der Batterie geben zu können, ist dieser komplette Frequenzbereich allerdings nicht nötig. Eine der wichtigsten Frequenzen für die Alterungsaussage ist der Bereich um 1 Hz. Dieser kann ein Anhaltspunkt für den SoH der Zelle sein. In der Abbildung 3.5 ist die Zellalterung aus Kapitel 2.4 nochmals dargestellt. Es sind die Impedanzspektren mit 0 Zyklen und nach 700

Zyklen bzw. nach sieben Wochen künstlicher Alterung zu sehen. Es sind auch exemplarisch drei verschiedene Signalfrequenzen aufgezeigt. Zu erkennen ist, dass sich das gesamte Impedanzspektrum mit zunehmender Alterung nach rechts verschiebt. Charakteristisch ist der Wendepunkt vom fallenden kapazitiven, zum steigenden kapazitiven Anteil bei der Signalfrequenz bei ca. 1 Hz.

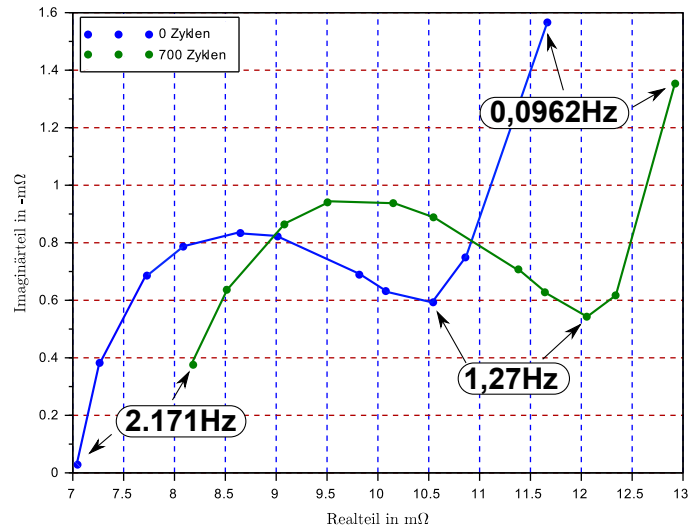


Abbildung 3.5.: Zellaalterung - Einzelne Frequenzen

Geht man in den höheren Signal-Frequenzbereich, so erkennt man, dass bei hohen Frequenzen die kapazitiven Anteile weniger werden und die Impedanz reell wird. In diesem Frequenzbereich haben die elektrochemischen Eigenschaften der Batteriezelle wenig Einfluss. Beeinflusst wird dieser Bereich eher durch die eingesetzten Materialien und die Kontaktwiderstände. In den meisten Datenblättern von Batteriezellen wird deren Wechselstromwiderstand bei einer aufgeprägten Signalfrequenz von 1 kHz gemessen. Dadurch erhält man den Widerstand der Zelle, ohne den Einfluss der chemischen Vorgänge [68]. In [61] wird angegeben dass bei der Impedanzspektroskopie typischerweise bis 2 kHz gemessen wird.

Geht man in den Bereich unter 1 Hz, lässt sich eine Aussage über die Diffusionstransporte innerhalb der Zelle machen. Dieser Bereich erstreckt sich typischerweise bis zu einigen mHz. Durch den großen Zeitaufwand sind Messungen unterhalb von 10 mHz aber recht selten [61]. Ausreichend ist bereits eine Vermessung bis 100 mHz. Es kann nun festgehalten werden, dass für eine komplette Impedanzspektroskopie der Frequenzbereich von 100 mHz bis mindestens 2 kHz interessant ist.

### 3.2.3. Impedanzbereich

Die bisher gemessenen Impedanzen an der A123 LiFePO<sub>4</sub> Zelle hatten alle einen Realanteil im Bereich von ca. 7 mΩ bis ca. 17 mΩ. Der Imaginärteil liegt bei ca. 6 mΩ. Für das richtige Hardwarekonzept ist besonders der untere Innenwiderstandsbereich der Impedanzspektroskopie wichtig. Ein kleinerer Innenwiderstand bedeutet eine kleine Spannungsamplitude, die gemessen werden muss. Dementsprechend muss die Hardware auf die zu messende Impedanz ausgelegt werden. Der obere Wert des Realanteils ist für die Konzeption wenig von Bedeutung, da die zu messende Amplitude mit steigendem Widerstand auch ansteigt und dadurch einfacher zu messen ist.

Allerdings hängt der Innenwiderstand der Zelle stark von der Größe und Bauform ab. Um einen Überblick über die gängigen Innenwiderstände zu bekommen, werden in Tabelle 3.2 einige LiFePO<sub>4</sub> Batteriezellen hinsichtlich ihres Innenwiderstands verglichen. Dabei ist zu erkennen, dass der Innenwiderstand, abhängig von ihrer Kapazität und deren Bauform, stark variiert.

Tabelle 3.2.: Übersicht Innenwiderstand

	Innenwiderstand bei 1 kHz	Nennkapazität	Bauform
LiNANO Headway 40152SE	5 mΩ	15 Ah	Zylinder
A123 ANR26650M1-B	6 mΩ [1]	2500 mAh	Zylinder
ECC-LFPP 45Ah	1,2 mΩ [20]	45 Ah	Zylinder
A123 AHP14M1-A	1,3 mΩ	14 Ah	Pouch-Zelle

Die Werte der Innenwiderstände der ECC-LFPP 45Ah Zelle<sup>2</sup> sowie der A123 ANR26650M1-B konnten bereits durch Messungen bestätigt werden. Der kleinste Innenwiderstand liegt hier bei etwas über 1 mΩ. Somit wird als Untergrenze des kleinsten noch zu messenden Innenwiderstands mit 1 mΩ festgelegt.

<sup>2</sup>siehe dazu Anhang E

### 3.2.4. Spannungsbereich

Ein Spannungsbereich, in dem die Impedanzspektroskopie durchgeführt werden soll, wird bei den kommerziellen Geräten nicht angegeben. Dennoch ist dieser Wert für die Dimensionierung der Hardware wichtig. Primäres Ziel ist es, mit den Zellsensoren  $\text{LiFePO}_4$  Batteriezellen zu vermessen. Diese besitzen einen mittleren Spannungsbereich von 3,4 V. Die Entladeschlussspannung beträgt dabei max. 2,0 V und die Ladeschlussspannung liegt typischerweise bei 3,6 V.

Als unteren max. Spannungsbereich können die 2,0 V der Entladeschlussspannung angenommen werden. Als oberer min. Spannungsbereich, der in jedem Fall noch gemessen werden soll, werden die 3,4 V des mittleren Spannungsbereichs gewählt.

### 3.2.5. Phasengenauigkeit

Die Phasengenauigkeit wird bei den kommerziellen Labormessgeräten zu  $1^\circ$  angegeben. Dies bedeutet, es lässt sich bereits eine Phasenverschiebung zwischen Strom- und Spannung von  $1^\circ$  detektieren. Bei niedrigen Frequenzen ist eine Detektierung zeitlich eher unkritisch, da die Perioden entsprechen lang sind und einer Verschiebung um  $1^\circ$  dementsprechend länger dauert. Bei schnelleren Frequenzen sind die Zeiten für eine  $1^\circ$  Verschiebung bereits im  $\mu\text{s}$  Bereich. So ist bei einem 100 Hz Signal der zeitliche Unterschied bei einer Verschiebung um  $1^\circ$  lediglich  $27,7\mu\text{s}$ . Bei schnelleren Signalen verkürzt sich die Zeit entsprechend. Um diese Verschiebung durch das Batteriesteuergerät sowie den Zellsensor messen zu können, ist eine hohe Synchronität der Messwerte zwischen Strom- und Spannungsmessung nötig.

Ziel soll für die Implementierung der Impedanzspektroskopie auch eine Phasengenauigkeit von  $1^\circ$  sein. Ob diese Genauigkeit aber durch das Messsystem, aufgrund der nötigen Synchronität, erreicht werden kann muss erst noch überprüft werden.

### 3.3. Synchronisation des Messsystems

Die Synchronisierung der Messwerte ist eines der grundlegenden Anforderungen an das gesamte Messsystem. Dabei ist nicht nur die einzelne Synchronität zwischen Batteriesteuergerät und Zellsensor wichtig, sondern auch die Synchronität unter den einzelnen Sensoren, da jeder Sensor seinen Messwert zur gleichen Zeit aufnehmen muss. Es muss also zwischen zwei verschiedenen Synchronisationen unterschieden werden. Im Folgenden sollen diese beiden Synchronitäten untersucht und im Falle eines Fehlers deren Auswirkungen auf das Messergebnis hin betrachtet werden.

#### 3.3.1. Synchronisation der Messwerte

In diesem Abschnitt wird die Synchronität zwischen Batteriesteuergerät und Zellsensor betrachtet. Dabei soll untersucht werden, wie sich ein Fehler in der Synchronisation auf das Messergebnis auswirkt. Anhand dieser Untersuchungen können die genauen Anforderungen an das Messsystem ermittelt werden. In einer ersten theoretischen Annäherung an das Verhalten wird eine Berechnung mit einem Strom und einer dazu synchronen Spannung durchgeführt. Dabei wird ein Strom mit 2,0 A und die dazu synchrone Spannung mit 2,0 V angenommen. Beide haben eine Frequenz von 1 Hz. Im Falle einer synchronen Messung von Strom- und Spannung ergibt sich eine Impedanz, berechnet durch das ohmsche Gesetz, von  $\underline{Z} = 1 \Omega + j0 \Omega$ .

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{2 \text{ V} \cdot (\sin(0^\circ) + j \cdot \cos(0^\circ))}{2 \text{ A} \cdot (\sin(0^\circ) + j \cdot \cos(0^\circ))} = 1 \Omega + j0 \Omega \quad (3.1)$$

Bei einer nicht synchronen Aufnahme verändert sich das Ergebnis der Impedanz. Es wird nun von einem Synchronisationsfehler von 125 ms ausgegangen. Dies bedeutet bei einer Frequenz von 1 Hz, eine Verschiebung des Spannungssignals um  $45^\circ$ , da der Strom 125 ms vor dem Spannungssignal aufgenommen wird. Den daraus resultierenden zeitlichen Strom- und Spannungsverlauf zeigt Abbildung 3.6.

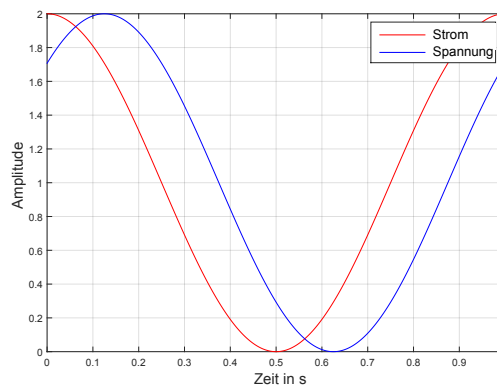


Abbildung 3.6.: Synchronisationsfehler zwischen Strom und Spannung um 125 ms

Durch die nicht synchrone Aufnahme von Strom und Spannung kommt es bei der Impedanz zu einer Veränderung, bedingt durch die vorhandene Phasenverschiebung von  $45^\circ$  der Spannung. Damit ergibt sich eine Impedanz von  $\underline{Z} = 0.7071 \Omega - j0.7071 \Omega$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{2V \cdot (\sin(45^\circ) + j \cdot \cos(45^\circ))}{2A \cdot (\sin(0^\circ) + j \cdot \cos(0^\circ))} = 0.7071 \Omega - j0.7071 \Omega \quad (3.2)$$

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass ein Synchronisationsfehler zwischen Strom und Spannung Einfluss auf die Impedanzmessung hat.

Nun ist zu untersuchen, in welchen Bereichen sich der mögliche Synchronisationsfehler im Messsystem bewegt und welche Auswirkungen dieser auf die gemessene Impedanz hat. Der Synchronisationsfehler setzt sich bei der Messung aus der Zeit zwischen der Stromaufnahme durch das Batteriesteuergerät und der Spannungsaufnahme durch den Zellsensor zusammen. In der Arbeit [62] wurde bereits festgestellt, dass sich zwischen Aussendung des Messimpulses durch das Batteriesteuergerät und dem Empfang durch den Zellsensor eine Laufzeit von  $18,4 \mu\text{s}$  befindet. Sobald das Taktsignal am Zellsensor ankommt, löst dieser die AD-Wandler Messung für die Spannung aus. Dieser ist so eingestellt, dass von der AD-Wandler Auslösung bis zur Aufnahme  $53,8 \mu\text{s}$  vergehen. Diese Zeit setzt sich zusammen aus 256 Takten (Sample-time) und 13 Takten (Convert-time). Durch die 5 MHz Taktung des AD-Wandlers ergeben sich die genannten  $53,8 \mu\text{s}$ .

Zusammen mit der Laufzeit des Taktsignals von  $18,4 \mu\text{s}$  ergibt sich ein Synchronisationsfehler von insgesamt  $72,2 \mu\text{s}$  zwischen Strom- und Spannungsaufnahme.

$$18,4 \mu\text{s} (\text{Laufzeit}) + 53,8 \mu\text{s} (\text{AD-Wandler Messzeit}) = 72,2 \mu\text{s} \quad (3.3)$$

In erster Näherung ist also von einem Synchronisationsfehler zwischen Strom- und Spannungsaufnahme von  $72,2 \mu\text{s}$  auszugehen. Dieser Synchronisationsfehler wird sich bei niedrigen Frequenzen wenig auf das Messergebnis auswirken. Bei einem 1 Hz Signal bedeutet der Fehler von  $72,2 \mu\text{s}$  eine Verschiebung zwischen Spannung und Strom von  $0,025848^\circ$ . Dabei entsteht einen Fehler von lediglich  $0,05\%$  im Imaginärteil.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{2V \cdot (\sin(0,025848^\circ) + j \cdot \cos(0,025848^\circ))}{2A \cdot (\sin(0^\circ) + j \cdot \cos(0^\circ))} = 1.0000 - j0.0005\Omega \quad (3.4)$$

Bei schnelleren Signalen wirkt sich der Fehler, aufgrund der kürzeren Periode, deutlich stärker aus. Bei einem 2 kHz Signal beträgt die durch den Synchronisationsfehler verursachte Verschiebung bereits  $51,984^\circ$ . Dabei entsteht neben dem Fehler im Imaginärteil auch ein Fehler im Realteil von  $38,41\%$ . Im Imaginärteil beträgt die Abweichung zum synchronen Messwert sogar  $78,78\%$ .

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{2V \cdot (\sin(51,984^\circ) + j \cdot \cos(51,984^\circ))}{2A \cdot (\sin(0^\circ) + j \cdot \cos(0^\circ))} = 0.6159 - j0.7878 \Omega \quad (3.5)$$

In Abbildung 3.7 ist zu erkennen, wie sich der Synchronisationsfehler bei einem 2 kHz Signal verhält.

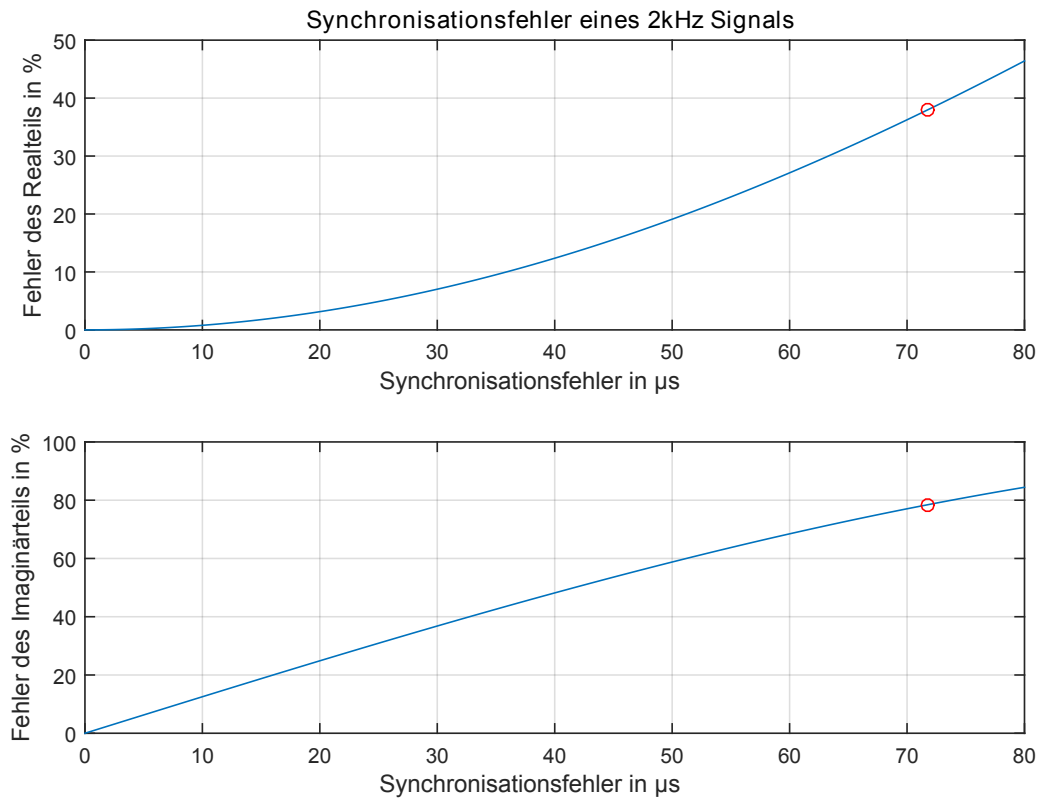


Abbildung 3.7.: Erste Näherung des Synchronisationsfehlers bei 2 kHz

Diese Rechnung zeigt, dass für die Realisierung der funksynchronisierten Impedanzspektroskopie die Synchronisierung der Strom- und Spannungsmessung sehr wichtig ist. Um eine Phasengenauigkeit von  $1^\circ$  zu erreichen, ist bei einem Signal von 2 kHz eine Mindestsynchronität von  $1,388 \mu\text{s}$  zu erreichen.

$$\frac{\text{Periodendauer}}{360^\circ} = \frac{500 \mu\text{s}}{360^\circ} = 1,388 \mu\text{s}/^\circ \quad (3.6)$$



Abbildung 3.8 zeigt den Einfluss des Synchronisationsfehlers bei unterschiedlichen Synchronisationsfehlerzeiten. Daraus folgt, dass sich der Fehler bei  $1,388 \mu\text{s}$  kaum mehr auf den Realteil der Impedanz auswirkt. Der Fehler des Imaginärteils liegt bei 2 kHz lediglich noch bei 1,741 %.

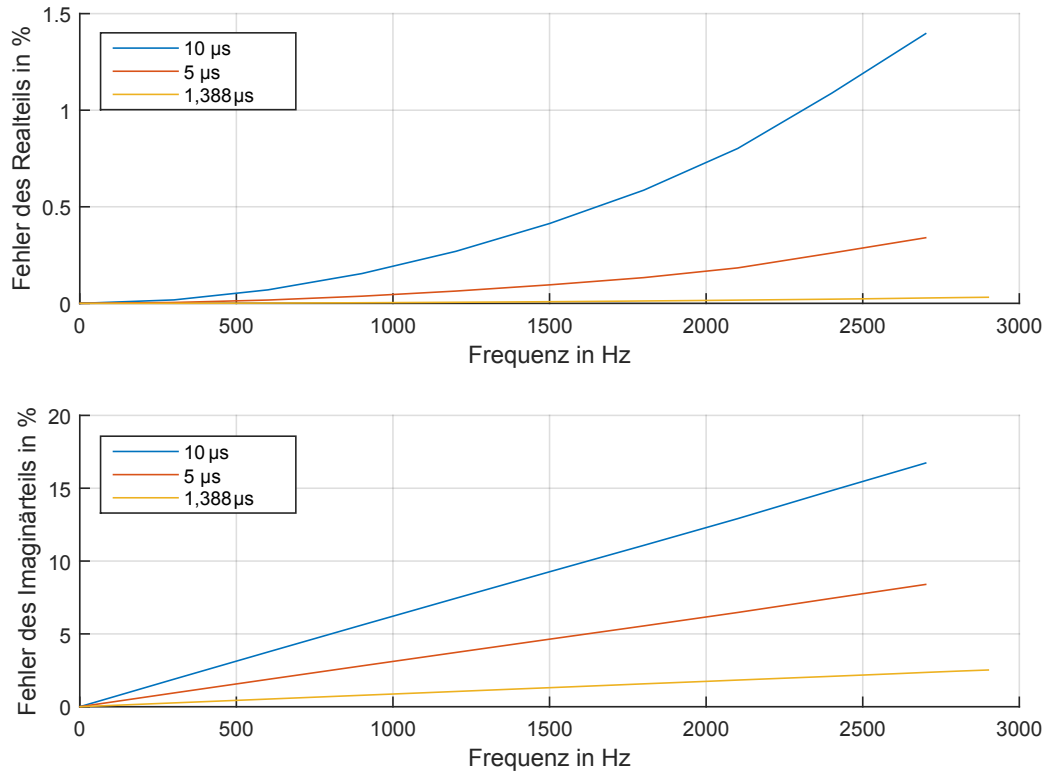


Abbildung 3.8.: Synchronisationsfehler in Abhängigkeit der Frequenz bei unterschiedlichen Synchronisationszeiten

Die Impedanzgenauigkeit für einen Synchronisationsfehler von  $1,388 \mu\text{s}$  liegt für ein 2 kHz Signal knapp unter 1 %. Somit kann auch für das Kriterium der Impedanzgenauigkeit der Wert von unter 1 % angegeben werden. Vorausgesetzt der Synchronisationsfehler liegt unterhalb der ermittelten  $1,388 \mu\text{s}$ .

### 3.3.2. Synchronisation zwischen den Sensoren

Die Synchronisation zwischen den einzelnen Zellsensoren ist wichtig, um die Messergebnisse untereinander vergleichen zu können. Ein Synchronisationsfehler wird hier im wesentlichen beeinflusst durch den Jitter, der bei der Demodulation des OOK-Signals an den einzelnen Zellsensoren entsteht. Diese Demodulation kann je nach Sensor unterschiedlich lange dauern, sodass die Zellsensoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten messen. Dazu wurden mit den Zellsensoren aus der Arbeit [48] Messungen hinsichtlich des Jitterverhaltens durchgeführt. Es wurden zwei unterschiedliche Zellsensoren vermessen und miteinander verglichen [70]. Ausgewertet wurden dabei 400 Messimpulse, die vom Batteriesteuergerät als Broadcastnachricht an beide Zellsensoren gesendet wurden. Dabei entstand eine maximale Abweichung zwischen den beiden Sensoren von 777,0 ns beim Empfang des Messimpulses. Die durchschnittliche Abweichung lag bei 206,9 ns. Man liegt dabei zwar noch unterhalb der 1,388  $\mu\text{s}$ , die im vorangegangenen Abschnitt ermittelt wurden, dennoch ist diese Zeit zu beachten, da dadurch die maximale erreichbare Genauigkeit limitiert wird.

#### Dynamische Laufzeitermittlung

Eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Laufzeiten bei den Zellsensoren zu detektieren, ist die sog. Ping-Pong Messung [5]. Das Messprinzip ist dabei die Laufzeitmessung eines Triggerimpuls der ohne jeglichen Datenzusatz zwischen Batteriesteuergerät und Zellsensor hin und her gesendet wird (Abbildung 3.9). Daher der Name der Ping-Pong Messung.

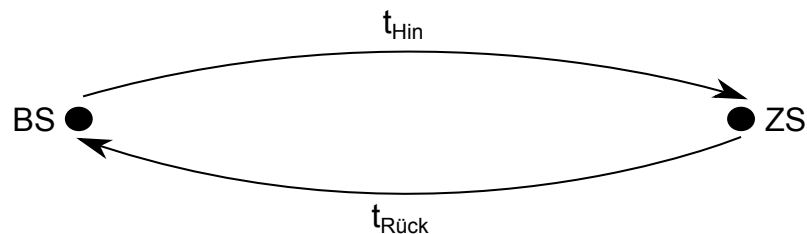


Abbildung 3.9.: Dynamische Laufzeitermittlung zwischen dem Batteriesteuergerät (BS) und dem Zellsensor (ZS)

Die Laufzeit des Triggerimpulses lässt sich durch die Zeiten des hin und her senden berechnen. Diese Messung berücksichtigt neben der eigentlichen Kanallaufzeit der Funkstrecke auch die Zeit, die für die Modulation bzw. Demodulation des Signals benötigt wird.

$$\text{Laufzeit} = \frac{(t_{\text{Hin}} + t_{\text{Rück}})}{2} \quad (3.7)$$

Durch die Messung an verschiedenen Zellsensoren lässt sich somit der Synchronisationsfehler  $\Delta_{\text{Synch}}$  zwischen den Zellsensoren berechnen.

$$\Delta_{\text{Synch}} = |\text{Laufzeit Sensor 1} - \text{Laufzeit Sensor 2}| \quad (3.8)$$

Inwieweit durch diese Messmethode ein Unterschied zwischen mehreren Zellsensoren ermittelt werden kann, muss durch praktische Untersuchungen noch ermittelt werden, da die zu messenden Zeiten sich in der Größenordnung von wenigen Taktzyklen des Zellsensors befinden. Allerdings bietet dieses Verfahren eine gute und einfache Möglichkeit, die Laufzeit einzelner Sensoren im System zu messen. Dadurch können Laufzeitfehler schnell detektiert werden.

### 3.4. Größe der Messamplitude

Die Größe der Messamplitude ist ein wichtiges Thema für die Genauigkeit der Impedanzmessung, da die falsche Wahl der Messamplitude eine Verfälschung der gemessenen Impedanz zur Folge haben kann.

Für die Messung der Spannungsamplitude ist es vorteilhaft, dass die Spannungsamplitude des Wechselanteils so groß wie möglich ist. Dies erleichtert deren Messung enorm und verbessert deren Genauigkeit. In erster Näherung, ist also eine große Strom-Anregungsamplitude zu wählen, da ein größerer Anregestrom eine größere Spannungsamplitude zur Folge hat. Dies kann bei Batterien allerdings problematisch werden, da es sich dabei um ein nichtlineares System handelt. Werden Messungen über einen nichtlinearen Bereich getätigt, entstehen Verzerrungen, die sich im Frequenzspektrum bemerkbar machen. Diese Problematik wurde bereits in den Vorgängerarbeiten [48] [2] und in der bekannten Literatur zur Impedanzspektroskopie [42] erklärt und ausführlich behandelt.

Hieraus ergibt sich die Frage, wie groß die Messamplitude werden darf und welche Auswirkungen eine Messung im nichtlinearen Bereich der Batteriezelle auf das gemessene Impedanzspektrum hat.

#### 3.4.1. Impedanzmessung an Batterien

Bei der Vermessung einer Batteriezelle ist ein besonderes Augenmerk auf die Anregungsamplitude zu richten, da die Batterieimpedanz stark stromabhängig ist. Diese Stromabhängigkeit wird durch den Widerstand  $R_{ct}$  verursacht [42], wie er bereits in Abschnitt 2.1.2 beschrieben wurde. Dabei wurde gezeigt, dass die Stromabhängigkeit des Widerstands  $R_{ct}$  und somit die Nichtlinearität des Systems durch die Butler-Volmer-Gleichung beschrieben werden kann. Nichtlinearitäten infolge von Temperatureinflüssen werden hier nicht betrachtet. Es wird von einer konstanten Temperatur ausgegangen.

Im Folgenden wird nun versucht, die Einflüsse an einem gemessenen Impedanzspektrum, die durch die Messungen an der Nichtlinearität entstehen, zu untersuchen. In Abbildung 3.10 ist die Nichtlinearität, beschrieben durch die Butler-Volmer-Gleichung, zu sehen. Es wurde dabei mit zwei unterschiedlichen Anregungsamplituden ohne Gleichstromanteil gemessen. Zum einen mit einer Anregungsamplitude von 0,5 A und zum anderen mit einer Anregungsamplitude von 5,0 A.

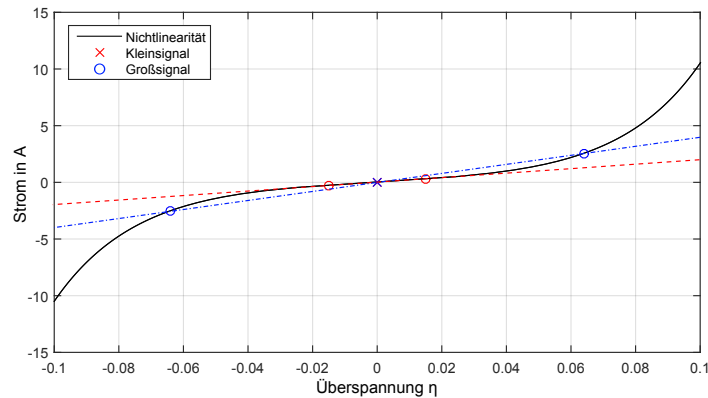


Abbildung 3.10.: Kleinsignalverhalten ohne Offset:  $R_{\text{Kleinsignal}} = 59,6 \text{ m}\Omega$ ,  $R_{\text{Großsignal}} = 25,6 \text{ m}\Omega$ ; Gleichstromanteil: 0,0 A, Kleinsignalamplitude: 0,5 A, Großsignalamplitude: 5,0 A

Die zu messende Impedanz ist jeweils die Tangente an der Nichtlinearität im Arbeitspunkt [42], in diesem Fall  $63,1 \text{ m}\Omega$ . Es ergibt sich hier für die Anregung mit 0,5 A eine Impedanz von  $R_{\text{Kleinsignal}} = 59,6 \text{ m}\Omega$ . Mit der Anregungsamplitude von 5,0 A liegt die ermittelte Impedanz bei  $R_{\text{Großsignal}} = 25,6 \text{ m}\Omega$ . Die Impedanzen der beiden Anregungsamplituden weichen um mehr als den Faktor zwei voneinander ab. Es ist also deutlich zu sehen, dass ein Unterschied zwischen einer Kleinsignalamplitude und einer Großsignalamplitude besteht.

Eine Verbesserung ergibt sich bei der Hinzufügung eines Gleichstromanteils. Dadurch wird der Arbeitspunkt der Messung in einen quasi-linearen Bereich geschoben. Dadurch wirkt sich die Nichtlinearität nicht so stark auf die Messergebnisse aus. In Abbildung 3.11 ist ein Gleichstromanteil von 3 A auf die Messamplitude beaufschlagt. Die Impedanzen zeigen, dass hier die Abweichungen zwischen Klein- und Großsignalamplitude wesentlich kleiner sind als ohne Gleichstromanteil.

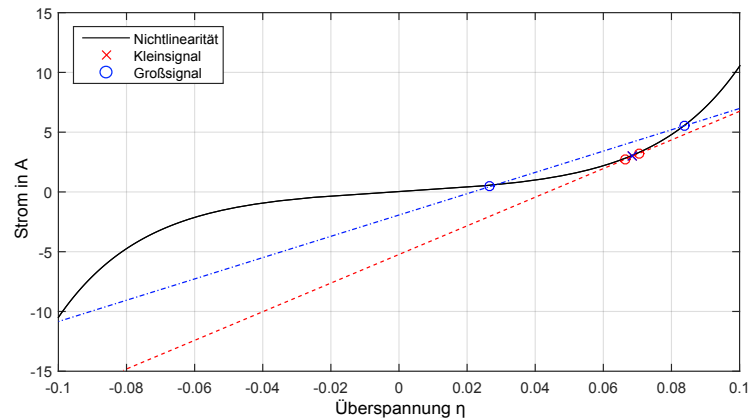


Abbildung 3.11.: Kleinsignalverhalten mit Offset:  $R_{\text{Kleinsignal}} = 8,3 \text{ m}\Omega$ ,  $R_{\text{Großsignal}} = 11,5 \text{ m}\Omega$ : Gleichstromanteil: 3,0 A, Kleinsignalamplitude: 0,5 A, Großsignalamplitude: 5 A

Dies zeigt, dass sich die Anregung immer aus einem Gleichstromanteil und einer relativ kleinen Anregungsamplitude zusammensetzen sollte. Zu sehen ist dies auch bei Messungen mit dem FuelCon TrueData-EIS, dabei wird auf den Anregeamplitudenanteil immer einen Gleichstromanteil hinzufügen.

In Abbildung 3.12 ist die Auswirkung auf das Impedanzspektrum eines einfachen Randles-Modells zu sehen (vgl. Abschnitt 2.3.1). Dieses Beispiel zeigt, dass der Fehler der Nichtlinearität besonders bei niedrigen Frequenzen einen Einfluss auf das Impedanzspektrum hat. Grund hierfür ist, dass bei hohen Frequenzen die zum Widerstand  $R_{\text{ct}}$  parallel liegende Kapazität  $C_{\text{dl}}$  niederohmig wird und somit den Hauptteil des Anregestroms trägt. Erst bei niedrigen Anregefrequenzen kommutiert der Anregestrom zum nichtlinearen Widerstand  $R_{\text{ct}}$  [42].

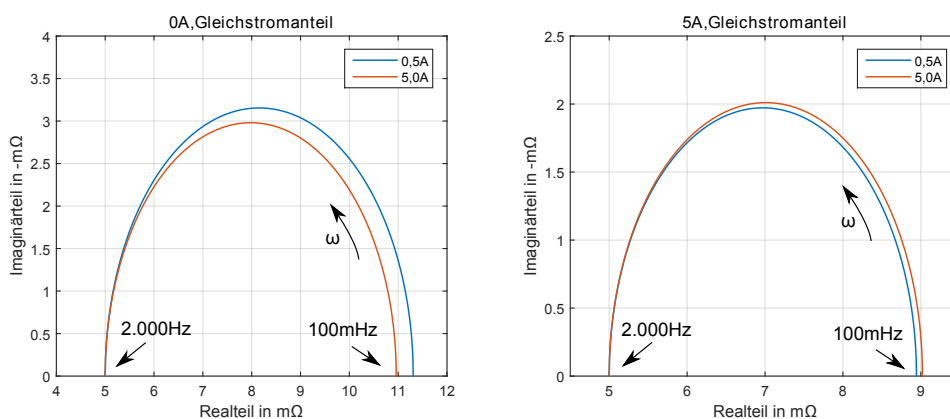


Abbildung 3.12.: Vergleich der abweichenden Impedanzspektren mit und ohne Gleichstromanteil

Über die genaue Größe der Anregungsamplitude gibt es in der Literatur keine konkreten Werte, da diese stark von der zu messenden Zelle abhängt. Allerdings werden Werte angegeben, die die maximale Größe der Messamplitude beschreiben. Diese sollen laut [4] den Wert von 10 mV nicht überschreiten, um in einem Quasi-Linearen-Bereich zu bleiben. In [2] wird angegeben, dass eine Messamplitude bis zu 5 mV genutzt werden kann, um eine Verzerrung durch die Nichtlinearität zu vermeiden. In [42] wird als Wert sogar 3 mV als guter Erfahrungswert angegeben.

Untersucht werden muss nun, wie groß die Auflösung des AD-Wandlers sein muss, um die Messamplitude noch in ausreichender Genauigkeit messen zu können. Es wurde festgelegt, dass das Messsignal noch mit mindestens 100 Stufen aufgelöst werden muss. Dadurch lässt sich die benötigte Auflösung des AD-Wandlers berechnen. Bei der Berechnung wird angenommen, dass der AD-Wandler eine Referenzspannung von 2,5 V besitzt. Dadurch ergeben sich die folgenden Auflösungen für die unterschiedlichen Messamplituden.

Um eine 3 mV Messamplitude mit einer Auflösung von mindestens 100 Stufen messen zu können, ist ein AD-Wandler mit einer Auflösung von 16,34 Bit notwendig.

$$\log_2 \left( \frac{2,5 V}{\left(\frac{3 mV}{100}\right)} \right) = 16,34 \text{ Bit} \quad (3.9)$$

Bei der Einhaltung, der in [2] angegebenen Messamplitude bis zu 5 mV, werden 15,61 Bit benötigt.

$$\log_2 \left( \frac{2,5 V}{\left(\frac{5 mV}{100}\right)} \right) = 15,61 \text{ Bit} \quad (3.10)$$

Nutzt man die Angabe mit einer Messamplitude von 10 mV, ergibt sich eine minimale Bitanzahl des AD-Wandlers von 14,61 Bit

$$\log_2 \left( \frac{2,5 V}{\left(\frac{10 mV}{100}\right)} \right) = 14,61 \text{ Bit} \quad (3.11)$$

Es lässt sich also festhalten, dass für die Impedanzmessung ein AD-Wandler mit mindestens 14,61 Bit vorhanden sein muss, damit eine Auflösung der Messamplitude von 10 mV in 100 Stufen erreicht werden kann. Vorzuziehen ist allerdings ein höherer Wert, um einerseits Störungen durch die Nichtlinearität der Batteriezelle zu vermeiden und andererseits eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Für die AD-Wandler Auswahl sollte daher eine höchst mögliche Auflösung gewählt werden. Es wird daher ein AD-Wandler mit einer Mindestauflösung von 15,61 Bit bevorzugt.

## 3.5. Neukonzeption des Messsystems

Im folgenden Abschnitt sollen verschiedene Konzepte für eine Messung der Wechselspannung behandelt werden. Dabei besteht das Hauptproblem darin, dass eine sehr kleine Wechselspannung mit einem großen Gleichspannungsanteil gemessen werden soll. Im vorangegangenen Abschnitt 3.4 wurde ermittelt, dass die zu messende Amplitude des Wechselsignals einen Minimalwert von 3 mV erreichen kann. Diese 3 mV müssen dann auch noch ausreichend gut aufgelöst werden.

Grundsätzlich gibt es dabei zwei verschiedene Arten, die Messung durchzuführen. Zum einen kann die Spannung direkt gemessen werden. Dazu wird ein hochauflösender AD-Wandler benötigt der die kleine Wechselspannung mit ausreichender Auflösung erfasst. Diese Art der Wechselspannungsmessung wurde bereits im vorhergehenden Zellsensor v0.4 verwendet. Eine weitere Art der Messung ist es, nur den Wechselanteil der Spannung ohne Gleichspannungsanteil zu messen. Dies hat den Vorteil, dass das Wechselsignal verstärkt und mit einem niedriger auflösenden AD-Wandler vermessen werden kann. Der Abzug des Gleichspannungsanteils kann z.B. über eine geeignete analoge Vorverarbeitung des Signals realisiert werden. Im Folgenden werden beide Messkonzepte vorgestellt und hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit überprüft. Dabei muss überprüft werden, ob weiterhin ein hochauflösender AD-Wandler verwendet werden soll oder ein Messkonzept mit analoger Vorverarbeitung erarbeitet wird.

### 3.5.1. Messkonzeption für eine hochauflösende Messung

Der Einsatz eines hochauflösenden AD-Wandlers wurde bereits in [48] erfolgreich getestet. Ein Problem dabei war, dass der gewählte AD-Wandler nur bis zu einer Frequenz von 350 Hz ausreichend genau messen konnte und somit nicht für eine komplette Impedanzspektroskopie an Batterien geeignet ist. Deshalb muss, falls diese Art der Wechselspannungsmessung angewandt wird, ein neuer AD-Wandler ausgewählt werden. Dazu werden nun einige geeignete Wandler und die momentan am Markt verfügbaren Techniken miteinander vorgestellt.

### SAR-Wandler

Ein Sukzessives Approximation Register (SAR) Wandler ist ein AD-Wandler-Typ, der heutzutage häufig als integrierter AD-Wandler in Mikrocontrollern vorkommt. Dieser Wandler Typ zeichnet sich durch eine sehr schnelle Sample-Rate bei einer geringen Leistungsaufnahme aus. Typischerweise erreichen die SAR AD-Wandler eine Auflösung von 16-18 Bit. Die SAR-Wandler nutzen dabei das Wägeverfahren, um sich der zu messenden Spannung anzunähern. Das bedeutet, dass der digitale Datenstrom dem analogen Signal bitweise angenähert wird. Dabei wandelt ein N-Bit AD-Wandler mit SAR-Technik eine Eingangsspannung innerhalb von N-Zyklen in einen digitalen Datenstrom um. Ein Komparator vergleicht dabei das analoge Eingangssignal mit dem Wert des digitalen Datenstroms. Dabei wird verglichen, ob der Wert des digitalen Datenstroms größer oder kleiner ist als das analoge Eingangssignal. Dementsprechend wird der Datenstrom bitweise erhöht bzw. erniedrigt. Dieses Prinzip zeigt die Abbildung 3.13.

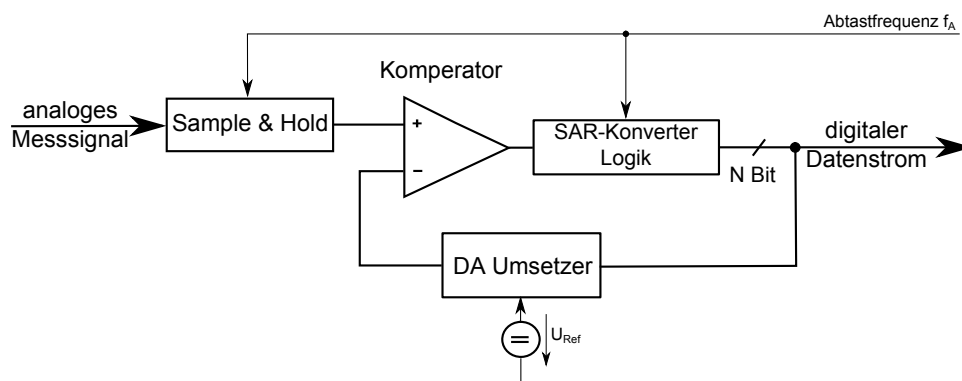


Abbildung 3.13.: Blockschaltbild eines SAR-AD-Wandlers (nach [67])

Typischerweise erreichen diese Art von AD-Wandlern nicht ganz so eine gute Auflösung wie Sigma-Delta Wandler, weshalb dieser Wandler-Typ hier auch näher betrachtet wird.

### Delta-Sigma-Wandler

Ein Delta-Sigma-Umsetzer erreicht deutlich höhere Auflösungen als ein SAR-Wandler. Grund hierfür ist eine spezielle Technik, die eingesetzt wird, um den Signal-Rausch-Abstand (SNR) zwischen Messsignal und dem Quantisierungsrauschen zu erhöhen. Der Delta Sigma Wandler nutzt dabei eine Überabtastung des analogen Eingangssignals, um das Quantisierungsrauschen über einen weiten Frequenzbereich hin zu verteilen. So bleibt



beispielsweise bei einer Verdoppelung der Abtastfrequenz, die Leistung des Quantisierungsrauschens konstant, verteilt sich dabei allerdings auf dem doppelten Frequenzbereich. Bei einem Delta-Sigma-Wandler wird neben der Verteilung des Quantisierungsrauschens auch eine sog. Rauschformung durchgeführt. Dies geschieht durch die Integration im Delta-Sigma-Wandler, wobei die Leistung des Quantisierungsrauschens hin zu höheren Frequenzen verschoben wird. Abbildung 3.14 zeigt dabei eine einfache schematische Darstellung der Rauschformung.

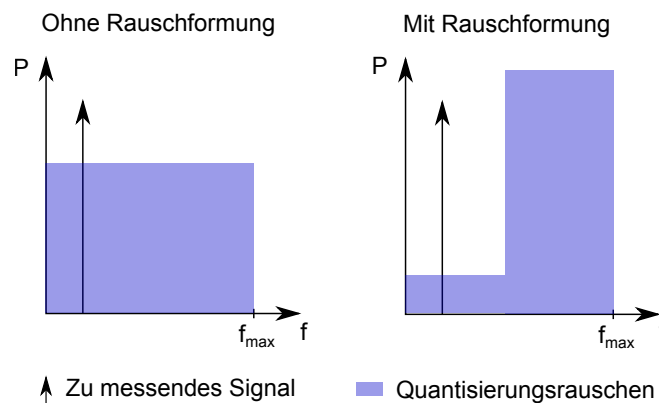


Abbildung 3.14.: Schematische Darstellung der Rauschformung (nach [67])

Durch diese Technik erreicht der Delta-Sigma-Wandler im unteren Frequenzbereich einen sehr guten SNR, weshalb er auch eine deutlich höhere Auflösung als ein SAR-Wandler erreicht. Abbildung 3.15 zeigt das Blockschaltbild eines Delta-Sigma-Wandlers 1. Ordnung.

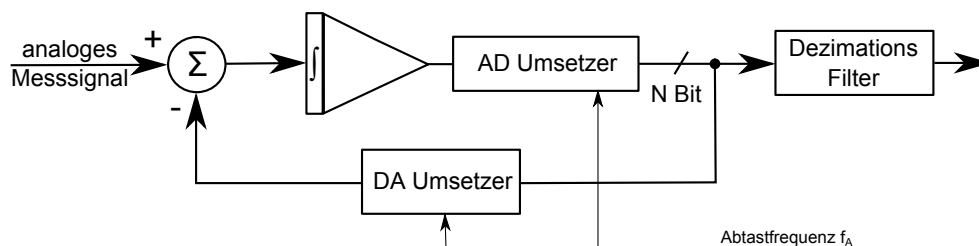


Abbildung 3.15.: Blockschaltbild eines Delta-Sigma-AD-Wandlers (nach [67])

Mit Delta-Sigma-Wandlern erhält man also eine wesentlich bessere Auflösung als mit dem SAR-Wandler. Allerdings erreichen diese Art der Wandler, bedingt durch die Rauschformung, eine geringere Sample-Rate.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen SAR-Wandlern und Delta-Sigma-Wandlern ist, dass der SAR-Wandler einen getakteten Eingang besitzt. Dadurch sind exakte Messungen bei einem Zeitpunkt möglich [67]. Der Delta-Sigma-Wandler besitzt keinen getakteten Eingang, sondern misst kontinuierlich und integriert den Durchschnittswert über eine bestimmte Zeit. Dadurch sind mit ihm keine Messungen zu einem Exakten Zeitpunkt möglich.

### AD-Wandler Auswahl

Für die Wahl eines geeigneten AD-Wandlers, wird eine Auswahl, der im Moment auf dem Markt gängigen AD-Wandler miteinander verglichen. Ein Wichtiges Kriterium ist dabei, dass die Spannungsaufnahmen des AD-Wandlers durch ein Signal unverzüglich ausgelöst werden kann. Dies ist notwendig, um die getaktete und synchrone Strom- und Spannungsaufnahme zu realisieren. Daher ist bei der Auswahl ein SAR-AD-Wandler vorzuziehen. Zwei sehr wichtige Kriterien sind die maximale effektive Auflösung und die maximale Datenrate des Wandlers. Der Wandler sollte eine minimale Auflösung von 15,61 Bit haben und eine Datenrate von mindesten 4 kSPS, um das Nyquistkriterium für ein Messsignal von 2 kHz zu erreichen.

Neben diesen Auswahlkriterien, ist auf die Versorgungsspannung des Wandlers zu achten. Der Zellsensor besitzt lediglich eine Spannungsversorgung von 3,3 V. Einige AD-Wandler benötigen aber eine Spannungsversorgung von 5,0 V. Um diese auf dem Zellsensor zu erreichen, ist ein zusätzlicher Hardwareaufwand erforderlich. Ein weiterer Hardwareaufwand wird auch verursacht, wenn eine externe Referenzspannung benötigt wird. Es ist also ein Wandler vorzuziehen, der über eine interne Referenzspannung verfügt. Zuletzt ist auch auf den Energiebedarf des Wandlers zu achten. Für erste Versuche kann auch ein Wandler eingesetzt werden, der einen höheren Energiebedarf hat. Wenn möglich ist aber ein Wandler mit niedrigem Energiebedarf zu wählen, um die Batteriezelle nicht unnötig zu belasten.

Tabelle 3.3.: Bewertungsmatrix AD-Wandler Auswahl

Eigenschaften	Sehr wichtig	Wichtig	Neutral
Wandlertyp	-	X	-
Auflösung	X	-	-
Datenrate	X	-	-
Versorgungsspannung	-	X	-
Referenzspannung	-	-	X
Energiebedarf	-	X	-

Die obenstehende Bewertungsmatrix gibt die Bewertung der einzelnen Eigenschaften und deren Gewichtung wieder. Anhand dieser Kriterien kann eine sinnvolle Auswahl eines geeigneten AD-Wandlers erfolgen.

Tabelle 3.4.: Übersicht verschiedener Digital-Analog-Wandler

Hersteller	Herstellerbezeichnung	Wandlertyp	Auflösung (max./ENOB)	Datenrate (max.)	Versorgungsspannung	Referenzspannung	Energiebedarf
AD	AD7767[9]	SAR	24 Bit/17,14 Bit	128 kSPS	2,5 V	extern	15,0 mW
AD	AD7690[11]	SAR	18 Bit/16,56 Bit	400 kSPS	5,0 V	extern	17,0 mW
AD	AD7641[8]	SAR	18 Bit/15,30 Bit	1.500 kSPS	2,5 V	2,048 V	75,0 mW
AD	AD7691[12]	SAR	18 Bit/15,82 Bit	250 kSPS	3,3 V	extern	1,35 mW bis 2,4 mW
AD	AD7176-2[10]	Delta-Sigma	24 Bit/20,09 Bit	250 kSPS	5,0 V	2,5 V	22,3 mW
AD	AD7989[13]	Delta-Sigma	18 Bit/12,53 Bit	100 kSPS	2,5 V	extern	700 $\mu$ W
LT	LTC2376-20[65]	SAR	20 Bit/17,64 Bit	250 kSPS	2,5 V	extern	5,25 mW
TI	ADS1291[31]	Delta-Sigma	24 Bit/15,07 Bit	8 kSPS	3,3 V	2,42 V	350 $\mu$ W pro Kanal
TI	ADS1271[30]	Delta-Sigma	24 Bit/16,07 Bit	105 kSPS	5,0 V	extern	92,0 mW
MI	MAX11200[37]	Delta-Sigma	24 Bit/19,00 Bit	120 SPS	3,3 V	2,5 V	300 $\mu$ W

Hersteller Abkürzungen: TI = Texas Instruments, AD = Analog Devices, LT = Linear Technology, MI = Maxim Integrated

Die Auswertung ergab, dass nicht alle der gewählten AD-Wandler die erforderlichen effektiven 15,61 Bit erreichen. Da die effektive Bitanzahl allerdings stark von der Datenrate abhängt, können diese Werte nicht genau miteinander verglichen werden. Es wurden nun zwei Wandler ausgewählt, die alle Mindestanforderungen erfüllen. Diese erfüllen neben den Anforderungen an die Datenrate und effektive Auflösung auch die Anforderung an einen geringen Energiebedarf. Ausgewählt wurden die beiden Wandler von Analog Devices AD7691 und von Linear Technology LTC2376-20.

- AD7691

Der AD7691 von Analog Devices ist ein schneller SAR-Wandler mit einer nominalen Auflösung von 18 Bit. Er erreicht eine effektive Auflösung von 15,82 Bit, womit eine Amplitude von 4,32 mV noch mit ausreichender Genauigkeit gemessen werden kann. Die Versorgungsspannung liegt dabei bei 3,3 V. Er kann somit mit der Spannungsversorgung des Zellsensors betrieben werden. Der Energiebedarf liegt bei 1,35 mW. Der einzige Nachteil ist, dass eine externe Referenzspannungsquelle eingesetzt werden muss.

- LTC2376-20

Der LTC2376-20 von Linear Technology ist ein hochauflösender SAR-AD-Wandler mit 20 Bit nominaler Auflösung. Effektiv werden 17,64 Bit erreicht. Es wird dabei eine Sample-Rate von bis zu 250 kSPS erreicht. Dieser benötigt ebenfalls eine externe Referenzspannungsquelle. Ein weiterer Nachteil im Vergleich zum AD7691 ist der höhere Energiebedarf von 5,25 mW. Dennoch wird er wegen seiner sehr guten Auflösung und der hohen Geschwindigkeit zum Test ausgewählt.

### **Messbereichseinstellung**

Die ausgewählten AD-Wandler haben beide einen Referenzspannungsbereich von 2,5 V. Um nun aber den geforderten Spannungsbereich von 2,0 V bis 3,4 V zu erreichen, muss die zu messende Spannung mindestens um 0,9 V abgesenkt werden um in den Referenzspannungsbereich zu kommen. Um dies zu erreichen, gibt es grundsätzlich drei unterschiedliche Möglichkeiten die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

- Spannungsreduzierung durch Spannungsteiler
- Gleichspannungs-Kompensation durch Filterung
- Spannungsreduzierung durch Gleichspannungs-Abzug

### Spannungsreduzierung durch Spannungsteiler

Spannungsreduzierung mittels eines Spannungsteilers ist zunächst ein sehr einfaches Prinzip, den Spannungsbereich von 2 V bis 3,4 V zu verkleinern. Zudem ist der Spannungsteiler leicht zu dimensionieren und hat einen sehr geringen Hardwareaufwand von lediglich zwei Widerständen. Durch den Einsatz eines 2:1 Spannungsteilers gelingt es die Spannung in den Bereich von 1 V bis 1,7 V zu verkleinern und somit in den Bereich des AD-Wandlers zu bringen. Ein Nachteil des Spannungsteilers ist es aber, dass dieser nicht nur den Gleichspannungsanteil verringert, sondern auch den Wechselanteil des Messsignals. Dadurch geht ein Bit Genauigkeit am Spannungsteiler verloren. So werden beim Einsatz des Spannungsteilers und einer Wechselspannungsamplitude von 3 mV nicht mehr 16,34 Bit, sondern 17,34 Bit benötigt.

$$\log_2 \left( \frac{2,5}{\left(\frac{3\text{mV}}{100}\right)/2} \right) = 17,34 \text{ Bit} \quad (3.12)$$

### Gleichspannungs-Kompensation durch Filterung

Eine effektive und zugleich einfache Art, den Gleichanteil des Messsignals auszukoppeln, ist die Gleichspannungs-Kompensation durch Filterung. Dabei kommt ein RC-Hochpassfilter zum Einsatz, der nur den Wechselanteil des Messsignals durch lässt und die Gleichspannung blockiert.

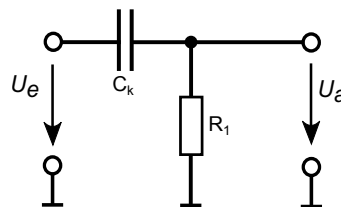


Abbildung 3.16.: Spannungs-Subtrahierschaltung

Dadurch, dass bei der Impedanzspektroskopie Messfrequenzen bis zu wenigen mHz gemessen werden sollen, muss die Grenzfrequenz des Filters weit unterhalb dieser Messfrequenzen liegen um die Messung nicht zu verfälschen. Die Grenzfrequenz  $f_G$  des Hochpass wird dabei maßgeblich durch den Wert des Kondensators  $C_k$  beeinflusst. Dieser muss ausreichend groß sein, damit die Grenzfrequenz  $f_G$  klein genug ist.

$$f_G = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C_k} \quad (3.13)$$

Abbildung 3.17 zeigt das Verhältnis zwischen Aus- und Eingangsspannung bei verschiedenen Frequenzen in Abhängigkeit der Kapazität des Kondensators. Zu sehen ist dabei, dass die Kapazität mit sinkender Frequenz stark ansteigt, um das Verhältnis zwischen der Ausgangsspannung  $U_A$  und der Eingangsspannung  $U_E$  auf den nötigen Wert von 1 zu halten, sodass die Messamplitude nicht verfälscht wird.

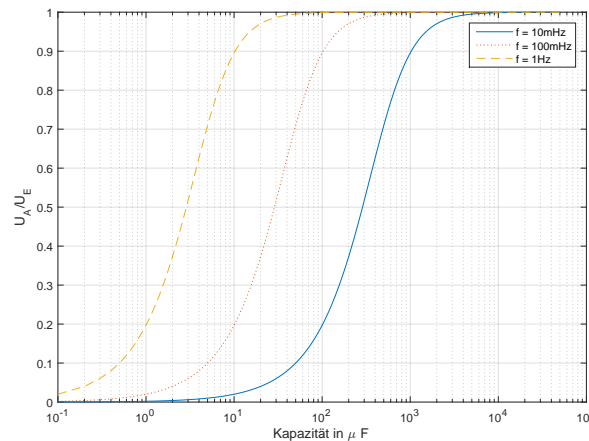


Abbildung 3.17.: Kapazität der DC-Filterung

Die Berechnungen zeigen, dass die Kapazität des Kondensators einen sehr großen Wert annimmt. Für eine Filterung bis 10 mHz sind dabei Kapazitäten nötig, bei denen die physische Bauteilgröße des Kondensators die Größe des Zellsensors weit überschreitet.

### Spannungsreduzierung durch Gleichspannungs-Abzug

Eine weitere Möglichkeit den Gleichspannungsanteil zu minimieren, ist die Spannungsreduzierung durch Gleichspannungs-Abzug. Dabei soll ein gewisser Gleichspannungsanteil vom zu messenden Signal abgezogen werden, ohne den Wechselanteil zu beeinflussen. Möglich ist dies durch eine Subtrahierschaltung.

Mit Hilfe dieser Schaltung ist es möglich, den gewünschten Messbereich von 2,0 V bis 3,4 V in den Referenzspannungsbereich des AD-Wandlers zu bringen. Mittels der beiden Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  (in Abbildung 3.18) lässt sich die abzuziehende Spannung einstellen. Diese werden so eingestellt, dass eine Spannung von min. 1,0 V abgezogen wird. Dadurch liegt der zu messende Spannungsbereich von 2,0 V - 3,4 V immer unterhalb der Referenzspannung des AD-Wandlers von 2,5 V und kann durch den Wandler erfasst werden.

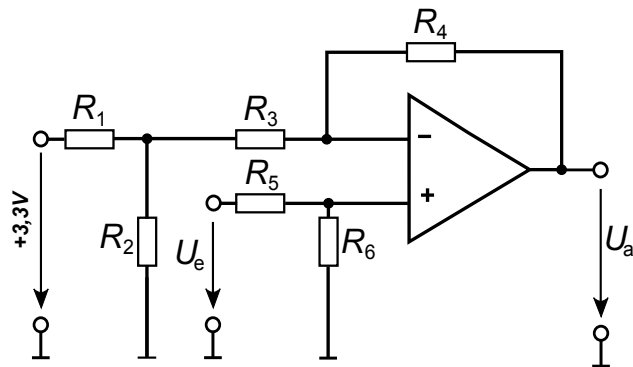


Abbildung 3.18.: Spannungs-Subtrahierschaltung

Ein Nachteil dieser Schaltung ist der mittlere Hardwareaufwand von einem Operationsverstärker und sechs Widerständen. Zusätzlich verschlechtert diese Schaltung die Energiebilanz des Zellsensors, da der Operationsverstärker versorgt werden muss und durch den Spannungsteiler ständig Strom fließt.

### Auswahl der Messbereichseinstellung

Mit allen drei vorgestellten Methoden lässt sich ein Gleichspannungsanteil eines Signals reduzieren. Sie sind aber nicht alle geeignet für den Einsatz bei einer Impedanzspektroskopie. So lässt sich die Gleichspannungs-Kompensation durch Filterung mittels Kondensator allein dadurch nicht realisieren, dass die Bauteilgröße des Kondensators die Zellsensorgröße bzw. die Zellgröße um ein Weites überschreiten würde, um bis in den niedrigen Frequenzbereich hinein messen zu können. Die Methode mittels Spannungsteiler wurde bereits in [48] erfolgreich eingesetzt. Durch die dadurch entstehenden Auflösungsreduzierung, wird sich an dieser Stelle aber gegen diese Art der Messbereichseinstellung entschieden. Es wird die Methode der Spannungsreduzierung durch Gleichspannungs-Abzug für den Test der ausgewählten AD-Wandler gewählt.

### Auswahl eines hochauflösenden AD-Wandlers

Beide ausgewählten AD-Wandler wurden mit der zuvor ausgewählten Schaltung zur Gleichspannungsreduzierung aufgebaut und getestet. Dabei konnten mit beiden AD-Wandlern Signale im geforderten Frequenzbereich und mit einer Amplitude von 3 mV aufgezeichnet werden. Beide AD-Wandler sind also geeignet für den Einsatz zur Erfassung der Spannung für die funksynchronisierte Impedanzspektroskopie. Für eine weitere Erprobung wurde sich für den Analog Devices AD7691 entschieden. Dieser hat zwar eine geringere Auflösung als der Linear Technology LTC2376-20, lieferte aber ausreichende gute Ergebnisse. Zudem zeigte er während der Vortests eine wesentlich bessere und einfachere Ansteuerbarkeit.

### 3.5.2. Messkonzeption für eine Messung mit analoger Vorverarbeitung

Ein weiteres Messkonzept für die Messung der Impedanzspektroskopie ist das mit der analogen Vorverarbeitung des Messsignals. Dabei wird das Messsignal soweit analog vorverarbeitet, dass es mittels des internen 12-Bit SAR AD-Wandlers des eingesetzten Mikrocontrollers gemessen werden kann.

Dabei soll, wie bei der Messbereichsanpassung des hochauflösenden AD-Wandlers, zuerst der Gleichspannungsanteil des Messsignals weitestgehend kompensiert werden und das verbleibende Signal soweit verstärkt werden, dass es von einem 12-Bit AD-Wandler ausreichend genau gemessen werden kann. Ein Problem dabei kann der flexible Spannungsbereich von 2,0 V bis 3,4 V darstellen. Es können maximal 2,0 V Gleichspannung abgezogen werden, da sonst Messungen im unteren Spannungsbereich nicht mehr möglich sind und so die Forderungen hinsichtlich des Spannungsbereichs nicht mehr sichergestellt werden können. Werden allerdings nur die 2,0 V abgezogen und der aktuelle Gleichspannungsanteil beträgt 3,3 V, heißt das, dass auch der restliche Gleichspannungswert von 1,3 V mit verstärkt wird. Somit kann nicht einmal um den Faktor zwei verstärkt werden, ohne den Referenzspannungsbereich von 2,5 V des AD-Wandlers zu überschreiten. Eine Lösung dieses Problems ist die dynamisch einstellbare Subtrahierschaltung. Dies ist eine normale Subtrahierschaltung, wie sie im vorherigen Abschnitt bereits erläutert wurde, deren Spannungsabzug aber durch den Mikrocontroller einstellbar ist. Erreicht wird dies durch einen Rheostaten<sup>3</sup>, der vom Mikrocontroller gesteuert wird und jeweils an den aktuellen Gleichspannungsanteil angepasst werden kann. Zusammen mit dem Widerstand  $R_1$  bildet der Rheostat einen Spannungsteiler, der dann die abziehende Spannung  $U_{\text{Abzug}}$  vorgibt.

$$U_{\text{Abzug}} = 3,3 \text{ V} \cdot \frac{R_{\text{Rheo}}}{R_1 + R_{\text{Rheo}}} \quad (3.14)$$

In Abbildung 3.19 ist die Subtrahierschaltung mit dynamisch einstellbarem Spannungsbereich mittels Rheostat zu sehen.

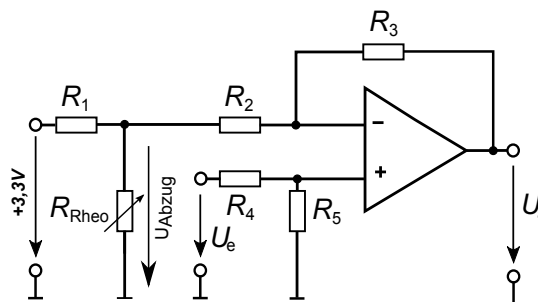


Abbildung 3.19.: Dynamisch einstellbare Subtrahierschaltung

<sup>3</sup>elektronisch einstellbarer Widerstand



Diese Schaltung unterscheidet sich zur der oben bereits vorgestellten Subtrahierschaltung lediglich durch den Rheostaten.

Nachdem das Messsignal einen geringeren Gleichspannungsanteil hat, kann dieses verstärkt werden. Diese Verstärkung erfolgt durch einen nicht invertierenden Verstärker am Ausgang der Subtrahierschaltung. Dessen Verstärkungsfaktor lässt sich mittels eines Spannungsteilers zwischen dem Ausgang des Verstärkers und dem negativen Eingang einstellen. Da es bei der Messung der Impedanzspektroskopie zu unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren, bedingt durch unterschiedliche Impedanzbereiche und Gleichspannungen kommen wird, muss der Verstärkungsfaktor auch einstellbar sein. Dazu wird hier wieder ein Rheostat eingesetzt. So lässt sich die Spannung des Spannungsteilers und somit auch der Verstärkungsfaktor des Verstärkers durch den Mikrocontroller während des Betriebs anpassen. Die komplette analoge Vorverarbeitung mit der Subtrahierschaltung sowie des nicht invertierenden Verstärkers zeigt Abbildung 3.20.

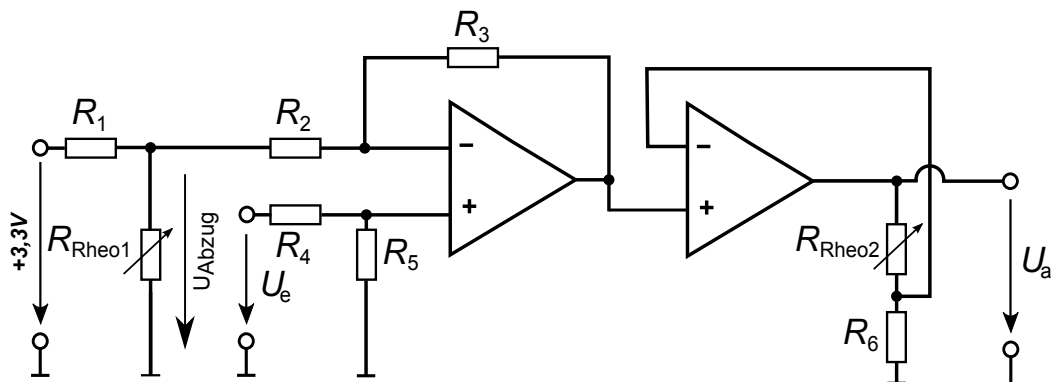


Abbildung 3.20.: Dynamisch einstellbare Subtrahierschaltung mit einstellbarer Verstärkung

Für den Grad der Verstärkung ist es wichtig, dass der Offsetanteil des Messsignals so gering wie möglich ist, um eine hohe Verstärkung des Wechselsignals zu erreichen. Um das Messsignal mit dem 12-Bit SAR AD-Wandler des CC430F5137 in der Aufteilung von 100 Spannungsstufen messen zu können, muss die Amplitude mindestens auf 61,04 mV verstärkt werden.

$$LSB = \frac{U_{\text{Ref}}}{2^{12}} \cdot 100 = \frac{2,5 \text{ V}}{2^{12}} \cdot 100 = 61,04 \text{ mV} \quad (3.15)$$

Bei einer Messamplitude von 3 mV bedeutet dies, dass das Signal um mindestens den Faktor 20,34 verstärkt werden muss, damit die 61,04 mV erreicht werden. Der restliche Offset darf dabei maximal 119,91 mV betragen, damit es zu keiner Verstärkung über die 2,5 V Referenzspannung des AD-Wandlers kommt. Für entsprechend größere Messamplituden wird der benötigte Verstärkungsfaktor dementsprechend kleiner und der maximale erlaubte Wert des Gleichspannungsanteils steigt an.

### 3.5.3. Vergleich der vorgestellten Konzepte

In Tabelle 3.5 wird ein kurzer Vergleich der beiden vorgestellten Messkonzepte gemacht. Dabei werden die Vor- und auch Nachteile der Konzepte gegenübergestellt.

Tabelle 3.5.: Vergleich der beiden vorgestellten Messkonzepte

Messkonzept	Vorteil	Nachteil
Hochauflösende Messung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signal kann einfach gemessen werden</li> <li>• Messung über den kompletten Frequenzbereich möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höchauflösende und schnelle AD-Wandler sind sehr teuer</li> <li>• Hohe Designanforderungen</li> </ul>
Analoge Vorverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messung über den kompletten Frequenzbereich möglich</li> <li>• kostengünstig realisierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mäßiger Hardwareaufwand</li> <li>• möglicher Fehlereinfluss durch die Vorverarbeitung</li> </ul>

Zur Auswahl stehen die Lösungen mittels hochauflösendem AD-Wandler mit Gleichspannungskompensation und der Lösung mit einer analogen Vorverarbeitung und der Spannungsaufnahmen durch den internen 12-Bit AD-Wandler des eingesetzten Mikrocontrollers. Mit beiden Konzepten ist eine theoretische Messung der elektrochemischen Impedanzspektroskopie möglich.

Ein großer Vorteil des Konzepts der hochauflösenden Spannungsmessung ist es, dass das Messsignal einfach gemessen werden kann. Das heißt, es kann ohne zusätzliche Verstärkung erfasst werden. Dadurch können keine Fehler durch die Verstärkung oder durch Toleranzen von Bauteilen auftreten. Toleranzen und Abweichungen bei der Subtrahierschaltung haben keinen Einfluss auf die gemessene Impedanz, da nur der Wechselanteil für die Messung in die Berechnung mit einbezogen wird. Nachteilig bei dieser Lösung ist der nicht zu unterschätzende Designaufwand für eine korrekte Messung durch den hochauflösenden AD-Wandler. So können schon kleine Einkopplungen in die Leiterbahnen die Messwerte verfälschen und somit unbrauchbar machen. Des Weiteren sind die doch erheblichen Kosten der hochauflösenden AD-Wandler zu beachten, die in der Größenordnung der kompletten restlichen Elektronik des Zellsensors liegen können.

Die Lösung mittels der analogen Vorverarbeitung des Messsignals ist hingegen wesentlich kostengünstiger. Es lässt sich ebenfalls der komplette Frequenzbereich der für die Impedanzspektroskopie an Batteriezellen nötig ist abdecken. Der aufgeführte Nachteil dieses Konzepts ist der mäßige Hardwareaufwand, welcher im Vergleich zu den Vorteilen relativ gering einzuschätzen ist. Ein weiterer Nachteil wird in der Anfälligkeit gegenüber Störungen und in den Bauteiltoleranzen an der Verstärkerschaltung gesehen, welche das

Messsignal verfälschen können. Dieser Nachteil lässt sich aber durch die Verwendung von Widerständen mit einer geringen Toleranz weitgehend minimieren. Ein wesentlicher Vorteil dieser Lösung ist, dass der Gleichspannungsabzug und die Verstärkung variabel einstellbar sind. Dieses ist gerade in der Entwicklungsphase sehr vorteilhaft, da man sämtliche Bereiche testen kann.

In Hinblick auf eine spätere Anfertigung einer größeren Testserie oder sogar einer Massenproduktion mit hochintegrierter Elektronik in einem Chip, ist es kostentechnisch wesentlich günstiger das Konzept der analogen Vorverarbeitung weiter zu verfolgen. Der Hardwareaufwand hält sich dabei in einem überschaubaren Rahmen. Es kommen neben den herkömmlichen Kondensatoren und Widerständen lediglich zwei Operationsverstärker sowie zwei Rheostaten zum Einsatz. Vorstellbar ist auch, dass sich im weiteren Verlauf die beiden Rheostaten durch zwei Widerstände ersetzen lassen, wenn nicht der komplette Spannungsbereich von 2,0 V bis 3,4 V genutzt werden soll. Dies würde die Kosten der Bauteile und den Hardwareaufwand nochmals reduzieren, ist aber Anwendungsfall abhängig und muss in der Praxis erst verifiziert werden.

### 3.6. Berechnung des Impedanzspektrums durch verteilte Signalverarbeitung

Die Berechnung des Impedanzspektrums ist ein wichtiges Thema dieser Arbeit. Es muss anhand der Strom- und Spannungswerte die komplexe Impedanz der Batteriezelle ermittelt werden. In der Arbeit [48] wurden die aufgenommenen Strom- und Spannungsdaten als Rohdaten von den Zellsensoren an das Batteriesteuergerät gesendet und auf einem externen Computer weiterverarbeitet. Dabei werden pro zu messenden Frequenzpunkt bis zu 1.900 Messwerte aufgenommen. Um die Messdaten zu übertragen, werden die Daten in einzelnen Paketen mit jeweils 25 Messdaten an das Batteriesteuergerät gesendet. Dabei entsteht eine Paketgröße von 54 Byte, bestehend aus 50 Byte an Messwerten plus 4 Byte Header [62]. Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 kbps ergibt das eine Übertragungszeit von 4,32 ms pro Paket. Für die komplette Übertragung der 1.900 Messwerte dauerte es dann 164,2 ms. Für ein Beispiel aus der Elektromobilität stellt man fest, dass die Übertragungszeiten bei einer großen Anzahl an Batteriezellen stark ansteigt. So sind z.B. beim Opel Ampera insgesamt 288 Batteriezellen verbaut [66]. Kommen die Zellsensoren darin zum Einsatz, so beträgt die Übertragungszeit für alle Zellen bereits 47,29 s. Dabei ist auch nur die reine Übertragungszeit berechnet, ohne weitere Verarbeitungszeiten. Diese Zeit stellt also die minimale Übertragungszeit dar. Kritisch ist neben der Übertragungszeit, die Datenmenge die versendet wird. Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass es während der Übertragung zu einzelnen kurzen Übertragungsabbrüchen, bedingt durch Paketverluste, kommen kann. Diese können zwar beliebig oft wiederholt werden, stellen aber eine erhöhte Kanalbelastung dar. Eine einfache Lösung für das Problem ist die Reduzierung der Datenmenge.

Realisiert werden kann dies durch eine verteilte Signalverarbeitung der komplexen Spannung direkt auf dem Zellsensor. Dadurch müssen nicht mehr die kompletten 1.900 Messwerte übertragen werden, sondern nur noch der Real- und Imaginärteil der komplexen Spannung. Dies führt zu einer drastischen Reduzierung der Datenmenge sowie auch der Übertragungszeit. Im Falle des Opel Amperas beträgt die Übertragungszeit für alle 288 Zellen lediglich noch 138,24 ms anstatt der 47,29 s.

Es ist also sinnvoll, eine Signalverarbeitung direkt auf dem Zellsensor durchzuführen, anstatt zentral auf dem Batteriesteuergerät oder einem externen Computer. Um nun eine geeignete Berechnungsart zu finden, die für die Implementierung auf einem Mikrocontroller geeignet ist, werden im Folgenden mehrere Berechnungsarten vorgestellt und auf ihre Effizienz und deren Rechenaufwand hin verglichen.

## Frequenzanalyse

Wie bereits in den mathematischen Grundlagen zur Impedanzspektroskopie in Abschnitt 2.2.2 gezeigt, lässt sich die komplexe Impedanz aus der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung berechnen. Dazu müssen allerdings die aufgenommenen Strom- und Spannungsdaten vom Zeitbereich in den Frequenzbereich transformiert werden.

Aus der Signalverarbeitung sind verschiedene Methoden bekannt, wie sich Signale aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich transformieren lassen. Eine klassische Methode in der Signalverarbeitung ist die kontinuierliche Fourier Transformation [50].

$$\underline{X}(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt. \quad (3.16)$$

Diese Transformation erlaubt es, ein kontinuierliches Signal in ein kontinuierliches Spektrum zu überführen [53]. Wird diese Transformation mit den gemessenen Strom- und Spannungsdaten durchgeführt, erhält man durch Division der Frequenzspektren das Spektrum der gesuchten Impedanz  $\underline{Z}(\omega)$  [4].

$$\underline{Z}(\omega) = \frac{\mathcal{F}\{u(t)\}}{\mathcal{F}\{i(t)\}} \quad (3.17)$$

Da es sich bei den gemessenen Signalen aber um diskrete Messwerte handelt, müssen andere Algorithmen angewandt werden, die zur Verarbeitung diskreter Signale geeignet sind. Im folgenden Abschnitt werden daher drei Verfahren vorgestellt, mit denen eine Frequenzanalyse mit diskreten Signalfolgen möglich ist.

### 3.6.1. Diskrete Fourier-Transformation - DFT

Mit der diskreten Fourier Transformation (DFT) ist es möglich, zeitdiskrete Signale in ein frequenzdiskretes Spektrum zu transformieren.

Für kontinuierliche Signale gilt die DTFT:

$$\underline{X}(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot e^{-j\omega k} \quad (3.18)$$

Das Frequenzspektrum ist dabei eine kontinuierliche Funktion von  $\omega$  und ist periodisch mit  $2\pi$ . Für ein diskretes Signal mit der endlichen Länge  $0 \leq k \leq N-1$  lässt sich die  $\omega$ -Achse des Frequenzspektrums zwischen  $0 \leq \omega \leq 2\pi$  diskretisieren, indem die diskreten Frequenzspektren mit  $\omega = \frac{2\pi n}{N}$  in den Grenzen  $0 \leq n \leq N-1$  berechnet werden.

$$\underline{X}[n] = \underline{X}(e^{j\omega})|_{2\pi n/N} = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \cdot e^{-2j\pi nk/N} \quad (3.19)$$

Die DFT liefert ein komplexes Frequenzspektrum, welches in einen Real- und einen Imaginärteil aufgeteilt werden kann.

$$\text{Re}\{\underline{X}(\omega)\} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \quad (3.20)$$

$$\text{Im}\{\underline{X}(\omega)\} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \quad (3.21)$$

Für die Berechnung der N DFT-Koeffizienten sind jeweils N komplexe Multiplikationen der Folgeelemente mit den komplexen Faktoren und N Additionen der Multiplikationsprodukte notwendig. Der Rechenaufwand der direkten Form der DFT steigt quadratisch mit der Transformationslänge an [73]. Das bedeutet, für eine N-Punkt DFT benötigt die direkte Form der DFT  $N^2$  komplexe Multiplikationen.

### 3.6.2. Fast Fourier-Transformation - FFT

Die Fast Fourier-Transformation (FFT) gehört zu den Standardverfahren der digitalen Signalverarbeitung. Es ist ein von Cooley und Tukey 1965 entwickeltes Verfahren zur effektiveren Berechnung der DFT. Die Grundlage des Algorithmus besteht darin, die Berechnung der DFT der Länge N in zwei unterschiedlichen Berechnungen der Länge N/2 aufzuteilen. Dabei muss die Anzahl der aufgenommenen Abtastwerte einer Zweierpotenz entsprechen. Die Teilergebnisse dieser beiden Berechnungen werden dann wieder zu einem Ergebnis zusammengeführt. Der am häufigsten verwendete Algorithmus, der in der digitalen Signalverarbeitung verwendet wird, ist die Radix-2-FFT [73]. Der Vorteil der FFT besteht darin, dass das exponentielle Wachstum des Rechenaufwandes der normalen DFT durch ein lineares Wachstum der FFT ersetzt wird. Eine N-Punkt Radix-2-FFT benötigt dabei  $N \cdot \log_2(N)$  komplexe Multiplikationen und die gleiche Anzahl an komplexen Additionen [44] für eine Berechnung der DFT. Die Aufteilung der Berechnung wird bei der Radix-2-FFT in eine gerade und eine ungerade Teilberechnung aufgeteilt [73].

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot W_N^{nk} = \sum_{n=0,2,\dots}^{N-2} x[n] \cdot W_N^{nk} + \sum_{n=1,3,\dots}^{N-1} x[n] \cdot W_N^{nk} \quad (3.22)$$

Mit der Substitution der Indizes

$$\begin{aligned} n &= 2m \text{ für } n \text{ gerade} \\ n &= 2m+1 \text{ für } n \text{ ungerade} \\ M &= N/2 \end{aligned}$$

ergibt sich die Gleichung zu:

$$X[k] = \sum_{m=0}^{M-1} x[2m] W_N^{2mk} + \sum_{m=0}^{M-1} x[2m+1] W_N^{[2m+1]k} \quad (3.23)$$

Umgeformt ergeben sich zwei Transformationen der Länge  $N/2$

$$X[k] = \sum_{m=0}^{M-1} x[2m] W_N^{mk} + W_N^k \cdot \sum_{m=0}^{M-1} x[2m+1] W_N^{[m]k} \quad (3.24)$$

Eine  $N$ -Punkt DFT wird also zerlegt in zwei  $N/2$ -Punkt DFTs. Dadurch entsteht ein Zeiterparnis im Gegensatz zu der konventionellen Berechnungsmethode der DFT.

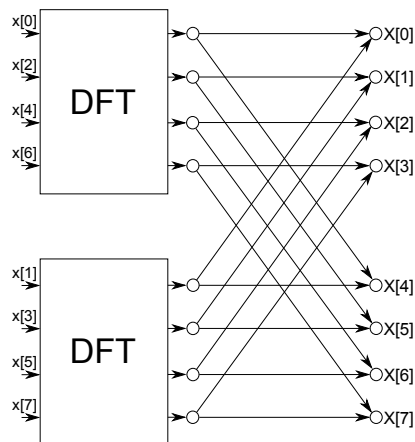


Abbildung 3.21.: Signalflussdiagramm einer Radix-2-FFT mit der Länge  $N = 8$

Allerdings hat auch diese Methode der DFT-Berechnung Nachteile. So ist die Berechnung der DFT nicht während der Laufzeit möglich, da alle Abtastwerte für die Berechnung vorhanden sein müssen. Daraus ergibt sich der zweite Nachteil, dass ein relativ großer Speicher vorhanden sein muss, um alle Abtastwerte speichern zu können.

### 3.6.3. Goertzel-Algorithmus

Eine effektive Art zur Berechnung einzelner Spektrallinien ist der 1958 von Gerald Goertzel publizierte Goertzel-Algorithmus [21]. Dieser wird beispielsweise in der Fernmeldetechnik angewandt, um das DTMF Wahlverfahren zu realisieren [7] [3], da dort auch nur einzelne Spektrallinien für die Auswertung benötigt werden. Der rechnerische Vorteil des Algorithmus gegenüber der DFT liegt darin, dass der Goertzel-Algorithmus die Anzahl der Multiplikationen ungefähr um den Faktor zwei reduziert [40]. Dieser Vorteil resultiert aus der im Algorithmus verwendeten Periodizität. Durch die Reduzierung der Berechnungsschritte, im Vergleich zur konventionellen DFT, ist dieser Algorithmus sehr gut geeignet für die Implementierung in einem DSP bzw. Mikrocontroller.

Ein Nachteil des Goertzel-Algorithmus ist laut [42] seine Anfälligkeit gegenüber numerischer Ungenauigkeit und den daraus entstehenden Fehlern.

Um den Aufbau der Filterstruktur zu verstehen, wird hier die Herleitung nachvollzogen [43]. Zunächst wird die DFT Grundgleichung aufgestellt.

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \cdot W_N^{nk} \quad (3.25)$$

$W_N^{nk}$  beschreibt dabei den Twiddle-Faktor:  $W_N^{nk} = e^{-j(2\pi kn/N)}$ . Aufgrund der Periodizität des Twiddle-Faktors [40] [54] für  $k \in \mathbb{N}$  gilt

$$W_N^{-Nk} = e^{j(2\pi kN/N)} = e^{j(2\pi k)} = 1 \quad (3.26)$$

Das heißt, dass  $W_N^{-Nk}$  auch an die Gleichung 3.25 multipliziert werden kann, ohne das Ergebnis der Gleichung zu verändern. Die Funktion lässt sich nun wie folgt beschreiben:

$$X[k] = W_N^{-Nk} \cdot \sum_{r=0}^{N-1} x[r] W_N^{nk}$$

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \cdot W_N^{[N-nk][-k]} \quad (3.27)$$

Um die Ausgangsfolge des Filters zu bestimmen, wird die Gleichung 3.27 mit der Folge  $u(n-r)$  multipliziert. Es ergibt sich daraus die folgende Ausgangsgleichung:

$$y_k[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x[r] W_N^{[N-nk][-k]} u[n-r] \quad (3.28)$$



Durch die Beschränkung  $x[n] = 0 \leq n \leq N-1$  kann die Gleichung als Faltung mit der Folge  $W_N^{[N-nk] [-k]} u[n-r]$  verstanden werden [54]. Deshalb kann  $y_k[n]$  als die endliche Ausgangsfolge des Filters angesehen werden. Aus den beiden Gleichungen 3.27 und 3.28 und durch die Beschränkungen, dass für  $x[n]$  gilt  $0 \leq n \leq N-1$ , lässt sich die folgende Gleichung aufstellen:

$$X[k] = y_k[n] |_{n=N} \quad (3.29)$$

Dies bedeutet, dass der Wert der Diskreten Fourier Transformation  $X[k]$ , der Ausgangswert  $y[n]$  des Filters ist, wenn  $n = N$  ist [23] [73] [54]. Die Gleichung 3.27 lässt sich auch einfach in eine rekursive Differenzgleichung überführen [23]:

$$y_k[m] = W_N^{-k} y[n-1] + x[n] \quad (3.30)$$

Mit den Koeffizienten  $a_1 = -W_N^{-k}$  und  $b_0 = 1$  lässt sich die Übertragungsfunktion des Goertzel-Filters 1. Ordnung aufstellen:

$$H[z] = \frac{1}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (3.31)$$

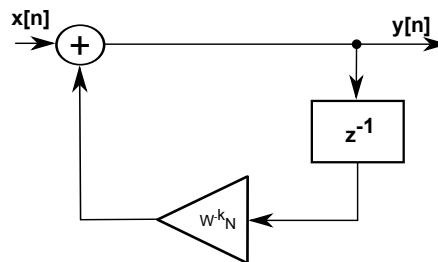


Abbildung 3.22.: Filterstruktur des Goertzel-Algorithmus 1. Ordnung

Das in der Abbildung 3.22 gezeigte Signalflussdiagramm zeigt noch nicht die effizienteste Umsetzung des Goertzel-Algorithmus. Für die Berechnung der  $N$ -ten Spektrallinie sind in dieser Form insgesamt  $2N$  komplexe Multiplikationen und  $2N$  komplexe Additionen notwendig. Dies entspricht  $4N$  reellen Multiplikationen und  $4N$  reellen Additionen [54]. Damit ist der Goertzel-Algorithmus 1. Ordnung sogar noch etwas schlechter als die direkte Berechnung durch die DFT. Ein Vorteil dieser Implementierung ist jedoch, dass die Berechnung des Filterkoeffizienten  $a_1 = -W_N^{-k}$  hier nur einmal durchgeführt werden muss und für alle anderen Rechenschritte genutzt werden kann.

Eine effizientere Art des Goertzel-Algorithmus zeigen die folgenden Schritte. Dabei lässt sich die Anzahl der Multiplikationen um den Faktor 2 reduzieren. Nimmt man die Übertragungsfunktion der Gleichung 3.31 und erweitert diese mit dem komplex konjugierten

Nenner der Gleichung, lassen sich die Nennerkoeffizienten der Übertragungsfunktion reell machen [73].

$$H[z] = \frac{1}{1 - W_N^{-k} \cdot z^{-1}} = \frac{1}{1 - e^{(j2\pi k/N)} \cdot z^{-1}} \quad (3.32)$$

$$H[z] = \frac{1 - e^{(-j2\pi k/N)} \cdot z^{-1}}{(1 - e^{(j2\pi k/N)} \cdot z^{-1}) \cdot (1 - e^{(-j2\pi k/N)} \cdot z^{-1})} \quad (3.33)$$

$$\frac{1 - e^{(-j2\pi k/N)} \cdot z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \cdot z^{-1} + z^{-2}} \quad (3.34)$$

mit  $e^{(-j2\pi k/N)} = W_N^k$  folgt

$$= \frac{1 - W_N^k z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) z^{-1} + z^{-2}}$$

Für die Realisierung der Filterstruktur wird die Direktform II gewählt. Der Vorteil dieser Form ist, dass beinahe die komplette Berechnung im rekursiven Teil des Filters stattfindet. Dabei kommt es im rekursiven Teil des Filters lediglich zu  $4N$  reellen Additionen und  $2N$  reellen Multiplikationen. Zusätzlich wird noch zum Zeitpunkt  $N=m$  die komplexe Multiplikation mit  $-W_N^k$  ausgeführt. Dies bedeutet nochmals zusätzliche vier reelle Multiplikationen und vier reelle Additionen. Damit ergibt sich der Gesamtaufwand für die Berechnung auf  $2(N+2)$  reelle Multiplikationen und  $4(N+1)$  reelle Additionen [54]. Das System kommt jetzt im Vergleich zu der Struktur 1. Ordnung mit ungefähr der Hälfte der Multiplikationen aus. Abbildung 3.23 zeigt die aus der Übertragungsfunktion resultierende rekursive Filterstruktur 2. Ordnung.

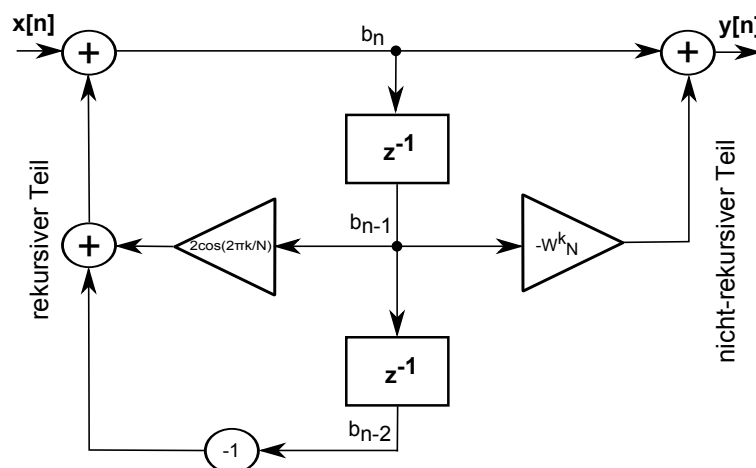


Abbildung 3.23.: Filterstruktur des Goertzel-Algorithmus (nach [64])

Die Ausgangsgleichung für  $y_k$  kann also wie folgt geschrieben werden:

$$y_k[m] |_{m=N} = X[k] = b_n - b_{n-1} \cdot W_N^k \quad (3.35)$$

### Vergleich der Berechnungsarten

Hier sollen nun die vorgestellten Berechnungsverfahren hinsichtlich ihres Rechenaufwandes miteinander verglichen werden.

Tabelle 3.6.: Aufwandsvergleich der DFT-Berechnung

	DFT	Radix-2-FFT	Goertzel (pro Spektrallinie)
Multiplikationen	$N^2$ komplex	$N \cdot \log_2 N$ komplex	$2(N + 1)$ reell
Additionen	$N(N - 1)$ komplex	$N \cdot \log_2 N$ komplex	$4(N + 1)$ reell

Es wird angenommen, dass innerhalb einer Recheneinheit pro zu berechnender komplexer Addition/Multiplikation zwei Taktzyklen und für eine reelle Addition/Multiplikation ein Taktzyklus benötigt werden. Dadurch lassen sich die einzelnen Berechnungsarten hinsichtlich ihrer Rechenlaufzeit miteinander vergleichen.

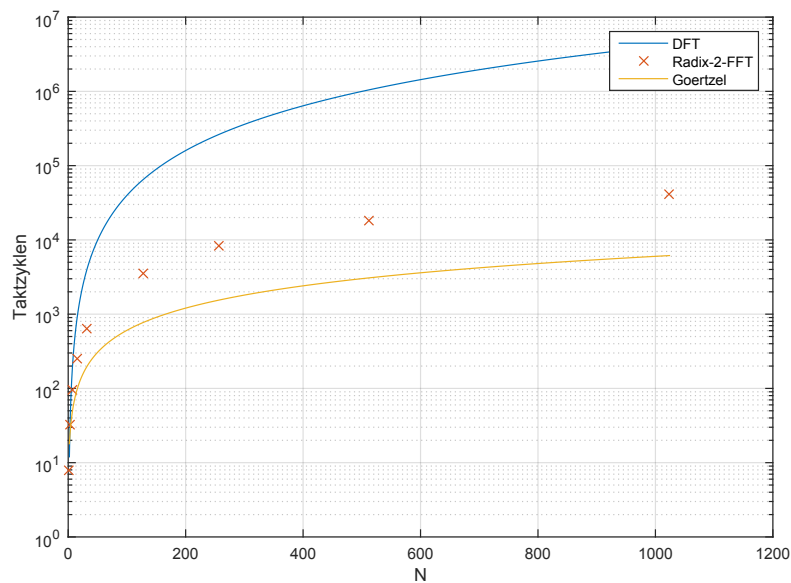


Abbildung 3.24.: Vergleich der Berechnungszeiten der Standard DFT, Radix-2-DFT und des Goertzel-Algorithmus

Die Abbildung 3.24 zeigt deutlich die unterschiedlichen Rechenlaufzeiten der einzelnen Berechnungsarten (Radix-2-FFT ist nur möglich für  $N = 2^p$  mit  $p \in \mathbb{N}$ ). Dabei ist

allerdings hinzuzufügen, dass bei der Berechnung durch die konventionelle DFT und der Radix-2-FFT die gesamten Spektrallinien berechnet werden. Dagegen wird bei dem Goertzel-Algorithmus nur eine Spektrallinie berechnet. Da bei der Impedanzspektroskopie im einfachsten Fall lediglich eine Spektrallinie berechnet werden muss, stellt der Goertzel-Algorithmus hinsichtlich seines Rechenaufwands aber das beste Verfahren dar. Man muss bei der Auswahl des Algorithmus stark darauf achten, für welchen Anwendungsfall man diesen einsetzen möchte. Müssen beispielsweise alle  $N$  Spektrallinien einer Folge berechnet werden, so benötigt man bei der Verwendung des Goertzel-Algorithmus ungefähr  $2N$  reelle Multiplikationen und  $2N^2$  reelle Additionen. Dies ist zwar immer noch geringfügig effektiver als die konventionelle Berechnung der DFT Werte, allerdings ist der Berechnungsaufwand auch quadratisch von  $N$  abhängig. In diesem Fall ist dann die Berechnung mit der Radix-2-FFT vorzuziehen.

In [42] wird angegeben, dass sich der Goertzel-Algorithmus lohnt, wenn weniger als  $\frac{5}{6} \cdot \log_2(N)$  Spektrallinien berechnet werden müssen. Werden mehr Spektrallinien gesucht, ist die Radix-2-FFT vorzuziehen.

### 3.7. Abschätzung und Zusammenfassung der Analyse

Im vergangenen Kapitel wurde ein Überblick über die Mindestanforderungen der funksynchronisierten Impedanzspektroskopie mit Zellsensoren geschaffen. Des Weiteren wurden verschiedene Konzepte für die Realisierung der Messmethode erarbeitet. Hier werden diese Konzepte nochmals zusammengetragen, um eine endgültige Neukonzeption des Messsystems zu erhalten. Ein Überblick über die erarbeiteten Mindestanforderungen für die Impedanzspektroskopie gibt die Tabelle 3.7.

Tabelle 3.7.: Mindestanforderung der Impedanzspektroskopie

	Mindestanforderung
Frequenzbereich	100 mHz - 2 kHz
Impedanzbereich	min. 1 m $\Omega$
Phasengenauigkeit	1°
Impedanzgenauigkeit	$\pm 1\%$
Spannungsbereich	2,0 V - 3,4 V

Aus diesen Anforderungen wird ersichtlich, dass ein Redesign des Zellsensors nötig ist. Zur Spannungsaufnahme der Messspannung wurden zwei Konzepte vorgestellt. Zum einen

die Spannungsaufnahme mit einem hochauflösenden AD-Wandler und zum anderen die Aufnahme durch das analog vorverarbeitete Spannungssignal mit dem, im Mikrocontroller integrierten AD-Wandler.

Es wurde entschieden, das Konzept mit der analogen Vorverarbeitung und der Spannungsaufnahme mittels internem AD-Wandler zu wählen. Des Weiteren soll aber die Messung durch einen hochauflösenden AD-Wandler als zusätzliche Alternative realisiert werden. Diese soll allerdings nur zum Vergleich dienen und als sekundäre Lösung angesehen werden. Realisiert wird die Messung mit dem hochauflösenden AD-Wandler als zusätzliche Aufsteckplatine.

Hinsichtlich der Software muss über die Komprimierung der Messdaten nachgedacht werden, um die vorhandenen Speicher-Ressourcen des Mikrocontrollers optimal ausnutzen zu können. Außerdem ist die Implementierung des Goertzel-Algorithmus auf den Zellsensoren wie auch dem Batteriesteuergerät zu realisieren.

Neben dem Redesign des Zellsensors soll auch das Batteriesteuergerät neu entwickelt werden. Es sollte ein deutlich leistungsstärkerer Mikrocontroller zum Einsatz kommen, mit dem auch die zeitkritischen Aufgaben der funksynchronisierten Impedanzspektroskopie verarbeitet werden können. Darüber hinaus muss das Batteriesteuergerät, neben der Möglichkeit mit den Zellsensoren zu kommunizieren, auch die Möglichkeit der Strommessung besitzen. Dies ist mit dem aktuell verwendeten Batteriesteuergerät nicht möglich.

## **4. Neuentwicklung und Redesign der bestehenden Hardware**

In diesem Kapitel soll die Neuentwicklung und das Redesign der bestehenden Hardware vorgestellt werden. Dabei soll zum einen ein leistungsstärkeres Batteriesteuergerät mit einer drahtlosen Verbindungsschnittstelle zu den Zellsensoren und einer Möglichkeit der Strommessung entwickelt werden.

Zum anderen wird ein Redesign des Zellsensors durchgeführt. Darauf soll die in Abschnitt 3.5.2 vorgestellte analoge Vorverarbeitung realisiert und in das bestehende Hardwarekonzept eingefügt werden. Eine zusätzliche Möglichkeit zur Messung der Impedanzspektroskopie soll durch die Entwicklung einer Erweiterungsplatine für den Zellsensor möglich sein, welche die Messung mittels des hochauflösenden AD-Wandlers durchführen kann.

### **4.1. Entwicklung des Batteriesteuergeräts**

Für eine schnelle Entwicklung eines Batteriesteuergeräts wurde entschieden, dieses auf der Basis eines Evaluations-Boards aufzubauen. Dies hat, neben der schnellen Verfügbarkeit, den Vorteil, dass diese meist kostengünstig erhältlich sind und sie eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten besitzen. Die Mindestanforderungen an das Evaluations-Board sind dabei klar gestellt. Es muss die Möglichkeit besitzen, zwei Erweiterungsplatinen ansprechen zu können und über genügend Rechenleistung verfügen, um die zeitkritischen Anforderungen der Impedanzspektroskopie zu erfüllen, sowie die Signalverarbeitung der Messdaten durchführen zu können.

Auf der Suche nach einem geeigneten Evaluations-Board, fiel die Wahl auf ein leistungsstarkes ARM Cortex-M4 Board von Texas Instruments, welches im Folgenden näher vorgestellt wird.

### 4.1.1. Basismodul des Batteriesteuergeräts

Als Basismodul für das Batteriesteuergerät wurde das Tiva C Series TM4C1294 Connected LaunchPad von Texas Instruments (Abbildung 4.1) ausgewählt. Dieses erfüllt alle Anforderungen, die an das Batteriesteuergerät gestellt werden und bietet darüber hinaus weitere Anschlussmöglichkeiten, sodass weitere Entwicklungen und Erweiterungen auf dessen Basis möglich sind. Auf dem Board kommt ein leistungsstarker ARM Cortex-M4 zum Einsatz, der mit einer Taktgeschwindigkeit von bis zu 120 MHz betrieben werden kann. Zudem besitzt das Board die Möglichkeit, zwei Erweiterungsmodule mit jeweils 40 Ein- /Ausgänge anzuschließen. Des Weiteren werden sämtliche Ein- /Ausgängen des Mikrocontrollers heraus geführt, sodass diese mit externen Bauelementen bzw. Schaltungen verbunden werden können.

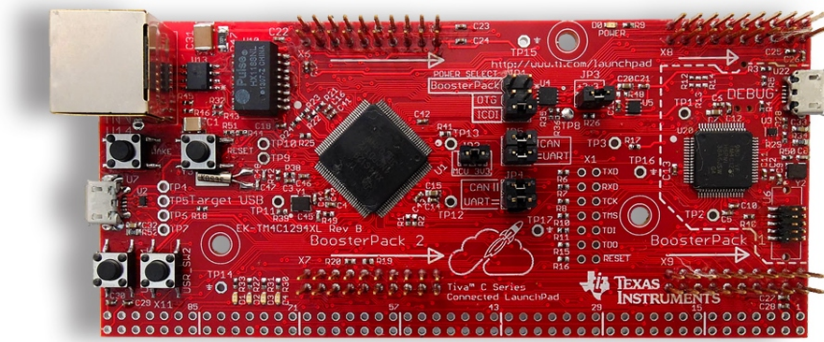


Abbildung 4.1.: Tiva C Series TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Board (entaus[36])

Das Evaluation-Board bietet sich somit als ideale Entwicklungsplattform für das Batteriesteuergerät an.

- leistungsstarker 120 MHz 32 Bit ARM Cortex-M4 CPU mit Floating-Point Einheit
- 1 MB Flash, 256 kB SRAM, 6 kB EEPROM
- 8 x 32-bit Timer
- 12 Bit 2 MSPS AD-Wandler
- 2 x 40 Pin Erweiterungssteckplätze
- Spannungsversorgung von 3,3 V und 5,0 V

### 4.1.2. Transceiver-Erweiterungsmodul

Um eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Batteriesteuergerät und den Zellsensoren herzustellen zu können, muss ein Transceivermodul entwickelt werden. In den Vorarbeiten [62] und [14] wird der Transceiver CC1101 von Texas Instruments verwendet. Aufgrund der bereits vorhandenen Erfahrungen mit diesem Baustein und der vorhandenen Software wurde entschieden, diesen auch wieder am neuen Batteriesteuergerät einzusetzen.

Durch den großzügig vorhandenen Platz von 50 mm x 28 mm auf dem Erweiterungsmodul, konnte beim Entwurf des PCB-Layouts auf das Referenzdesign des CC1101 von Texas Instruments zurückgegriffen werden [38]. Dadurch konnte das optimale Layout für das RF-Design gewählt werden. Dies besteht aus einem Anpassungsnetzwerk aus Induktivitäten und Kapazitäten, welche die Eingangsimpedanz des CC1101 an die Antennenimpedanz von  $50\Omega$  anpasst. Die genauen Werte des Anpassungsnetzwerks können dem Schaltplan des Erweiterungsmoduls im Anhang K entnommen werden.

Als Taktquelle besitzt der CC1101 Transceiver einen externen 26 MHz Quarz mit den entsprechenden Lastkondensatoren. Der Transceiver kommuniziert mit dem Mikrocontroller über eine, auf die seitlichen Steckerleisten herausgeführten, SPI-Schnittstelle. Neben dieser Schnittstelle werden die beiden frei konfigurierbaren Ein-/Ausgänge GDO0 und GDO2, welche für Interrupt-gesteuerte Meldungen wie das Empfangen eines Paketes genutzt werden, herausgeführt. Um diese Signale im Testbetrieb messen zu können, wurden zusätzliche Messpunkte auf der Platine vorgesehen. Die folgende Abbildung 4.2 zeigt das entworfene Layout des CC1101 Transceiver-Erweiterungsmoduls.

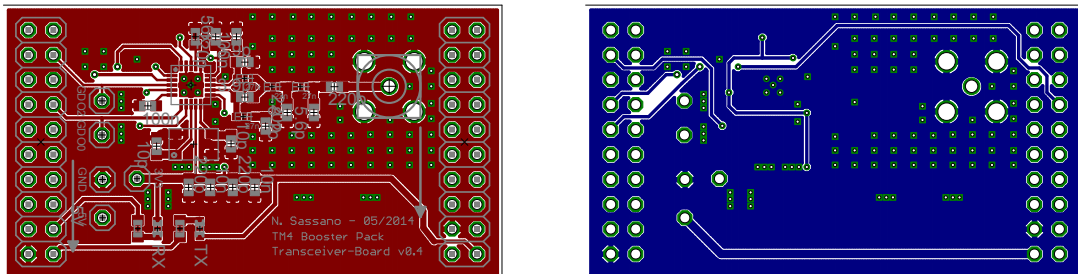


Abbildung 4.2.: Layout des CC1101 Transceiver-Erweiterungsmoduls

Links: Oberseite des Layouts. Rechts: Unterseite des Layouts

Darüber hinaus besitzt das Erweiterungsmodul zwei Sende- und Empfangs-LED die vom Mikrocontroller aus gesteuert werden und zur optischen Signalisierung vom Empfangen bzw. Senden von Datenpaketen dienen.



### 4.1.3. Strommess-Erweiterungsmodul

Die Realisierung der Strommessung erfolgt ebenfalls über ein Erweiterungsmodul, welches an das Batteriesteuergerät angeschlossen wird. Für die Strommessung soll ein Hall-Sensor eingesetzt werden, der in einem Chip integriert ist.

Gewählt wurde der Strommess-Sensor ACS716 von Allegro Microsystems. Dabei handelt es sich um einen Strommess-IC mit integriertem Hall-Sensor, der als Ausgabe eine lineare Spannung in Abhängigkeit vom durchflossenen Strom liefert. Dieser kann sowohl positive als auch negative Ströme messen. Die ausgegebene Spannung liegt dabei für positive Ströme im Bereich oberhalb und für negative Ströme unterhalb von 1,65 V. Diese Spannung kann vom AD-Wandler des Batteriesteuergeräts gemessen und in Stromwerte umgerechnet werden. Abbildung 4.3 zeigt das Layout des erstellten Erweiterungsmoduls. Gut zu erkennen sind dabei die beiden Stromanschlüsse des Erweiterungsmoduls. Diese befinden sich im unteren Teil der Platine. Die Stromkabel lassen sich durch eine Verschraubung (M6) mit dem Strommess-Erweiterungsmodul fest verbinden.

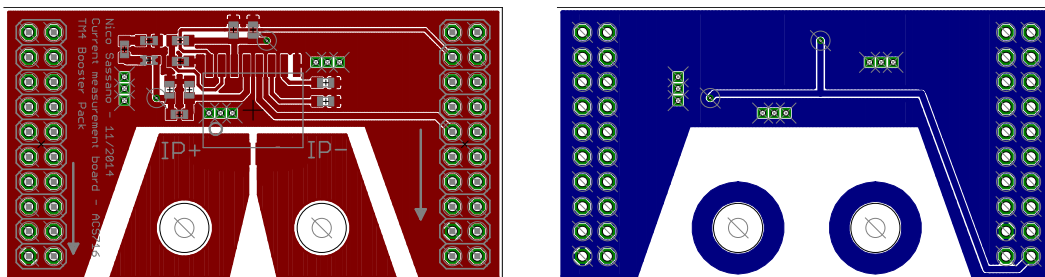


Abbildung 4.3.: Layout des ACS716 Strommess-Erweiterungsmoduls

Links: Oberseite des Layouts. Rechts: Unterseite des Layouts

Neben dem Strommess-IC besteht die restliche Beschaltung des Moduls aus Stützkondensatoren, einem Spannungsteiler für die ÜberstromEinstellung sowie einer Eingangsbreitenbegrenzung für das Strommessmodul. Über einen Enable-Eingang lässt sich die Messung des ACS712 ein- bzw. ausschalten. Dieser ist über die Steckerleiste zum Mikrocontroller geführt und lässt sich von diesem steuern. Ein genauer Schaltplan mit den Angaben der Dimensionierung findet sich im Anhang J.

Der Sensor ist in verschiedenen Strombereichen erhältlich, diese sind 6 A, 12 A sowie 25 A. Dabei unterscheiden sich die drei Varianten in der Strom-/Spannungsausgabe, die vom AD-Wandler des Mikrocontrollers gemessen wird. Dies ist bei der Berechnung der Stromwerte auf dem Batteriesteuergerät zu beachten.

#### 4.1.4. Aufbau des Batteriesteuergeräts

Das Batteriesteuergerät besteht aus insgesamt drei Komponenten. Dem Transceiver-Modul, dem Strommess-Modul und dem Basismodul, welches die Steuerung der Erweiterungsmodule übernimmt. In Abbildung 4.4 wird der Aufbau des Batteriesteuergeräts und die einzelnen Verbindungen zu den Erweiterungsmodulen dargestellt.

Durch eine UART-Verbindung zwischen dem Batteriesteuergerät und einem externen PC, lassen sich Daten abrufen und Befehle an das Steuergerät senden.

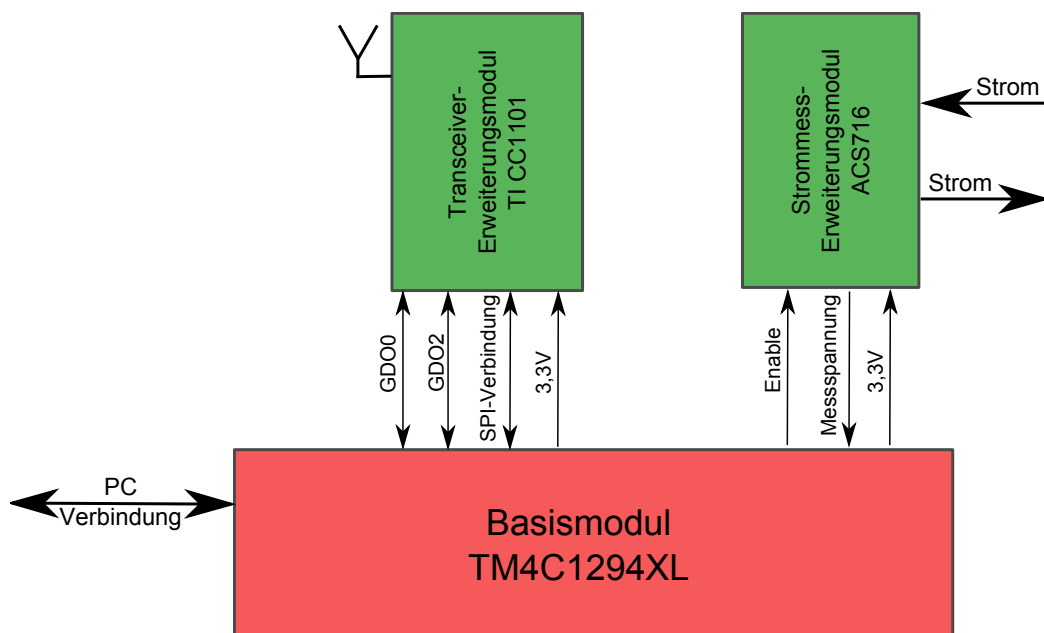


Abbildung 4.4.: Blockschaltbild des Batteriesteuergeräts

## 4.2. Redesign des Zellsensors

Im Laufe der Analyse hat sich gezeigt, dass ein Redesign des Zellsensors zwingend erforderlich ist, um die analoge Vorverarbeitung zu implementieren. Dabei soll die bisherige Hardware des Zellsensors beibehalten werden. Ebenfalls soll die Anschlussmöglichkeit für ein Erweiterungsmodul auf dem Zellsensor vorhanden bleiben.

Weiter soll der mechanische und elektrische Anschluss zur Verbindung des Zellsensors mit der Batteriezelle hinsichtlich der benötigten Fläche optimiert werden. Dadurch steht mehr Fläche für die Unterbringung der Bauteile zur Verfügung. Um eine weitere Optimierung der verfügbaren Fläche zu erhalten, wurde entschieden, sämtliche Standardbauelemente wie Widerstände, Induktivitäten sowie Kapazitäten in der Bauformgröße 0402 zu verwenden. Bisher wurden Standardbauelemente in der Größe 0603 verwendet.

### 4.2.1. Entwicklung der analoge Vorverarbeitung

Die analoge Vorverarbeitung wurde bereits in Kapitel 3.5.2 vorgestellt. Für die Realisierung der kompletten analogen Vorverarbeitung werden zwei Operationsverstärker, zwei Rheostaten sowie sechs Widerstände benötigt. Als Operationsverstärker wird ein OPA344 von Texas Instruments eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen energiesparenden Operationsverstärker, der somit sehr gut in das Low-Power-Konzept des Zellsensors passt. Dieser Operationsverstärker ist zudem in einer Variante erhältlich, in der zwei Operationsverstärker integriert sind (OPA2344). Beide Operationsverstärker können somit platzsparend innerhalb eines Gehäuses auf dem Zellsensor untergebracht werden.

Als Rheostat wurde der AD5270 von Analog Devices gewählt. Dabei handelt es sich um einen elektronisch einstellbaren Widerstand, der sich über eine SPI-Schnittstelle in 1024 Stufen zwischen  $0\ \Omega$  und seinem Nominalwert einstellen lässt. Der Rheostat AD5270 ist in drei verschiedenen nominalen Varianten  $20\ \text{k}\Omega$ ,  $50\ \text{k}\Omega$  und  $100\ \text{k}\Omega$  erhältlich.

Die Einstellung der analogen Vorverarbeitung bzw. der beiden Rheostaten ist abhängig vom Gleichspannungsanteil der Batteriespannung. Um die analoge Vorverarbeitung korrekt einstellen zu können, muss dem Mikrocontroller der Gleichspannungsanteil der Batteriespannung bekannt sein. Erfasst werden kann die Gleichspannung durch den internen 12 Bit AD-Wandler des Mikrocontrollers. Um den erforderlichen Spannungsbereich von  $2,0\ \text{V}$  bis  $3,4\ \text{V}$  durch den internen AD-Wandler des Mikrocontroller erfassen zu können, muss die Gleichspannung in den Referenzspannungsbereich ( $0,0\ \text{V}$  bis  $2,5\ \text{V}$ ) des Mikrocontrollers gebracht werden. Dies wird hier durch einen einfachen 2:1 Spannungsteiler realisiert, durch den dann eine Spannungserfassung im Bereich von  $0,0\ \text{V}$  bis  $5,0\ \text{V}$  mit dem internen 12 Bit AD-Wandler möglich ist. Der dadurch verursachte Auflösungsverlust durch den Spannungsteiler ist hier vernachlässigbar, da für diese Messung eine Genauigkeit im mV Bereich ausreichend ist. Die Abbildung 4.5 zeigt schematisch die Aufteilung der Zellspannung in zwei

verschiedene Pfade, die dann durch den internen 12 Bit AD-Wandler in verschiedenen Genauigkeiten gemessen werden kann.

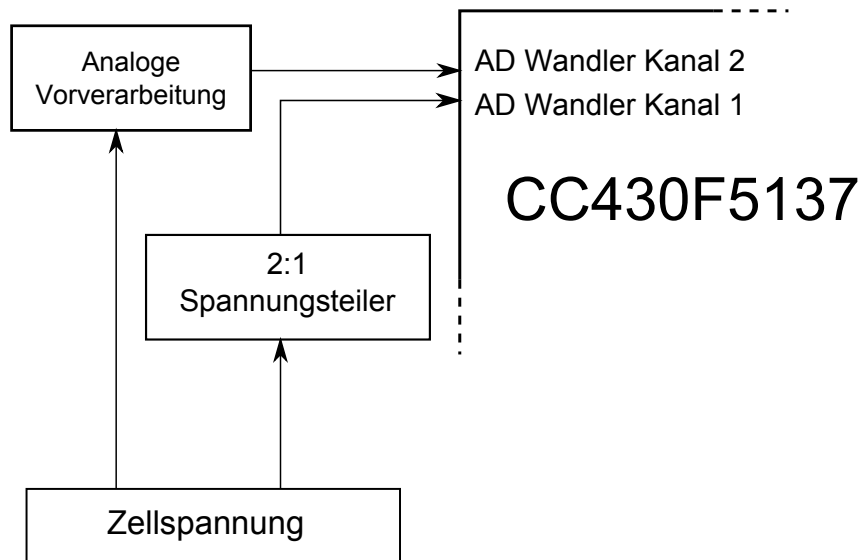


Abbildung 4.5.: Aufteilung der Zellspannung in zwei verschiedene Messpfade

### Dimensionierung der analogen Vorverarbeitung

An dieser Stelle werden die Bauteile für die analoge Vorverarbeitung dimensioniert und ausgelegt. Es müssen die beiden Spannungsteiler für den Gleichspannungsabzug und die Verstärkung der analogen Vorverarbeitung dimensioniert und eine Wahl des Nominalwertes der Rheostaten vorgenommen werden.

Für die Dimensionierung der Spannungsteiler an der Subtrahierschaltung ist es wichtig zu wissen, wieviel Spannung maximal abgezogen werden soll. Da der Zellsensor nur über eine 3,3 V Spannungsversorgung verfügt, welche für den Spannungsabzug eingesetzt werden kann, kann auch maximal diese Spannung abgezogen werden. Da die Batteriespannung im unbelasteten Fall bis zu 3,4 V Spannung haben kann, ist also der maximal erreichbare Spannungsabzug durch die Subtrahierschaltung zu realisieren. In diesem Fall würde noch eine restliche Gleichspannung von 100 mV am Ausgang der Subtrahierschaltung existieren.

Es wurde sich dafür entschieden, den Spannungsteiler in einem Verhältnis von 1:100 aufzubauen. Realisiert wird dieser durch einen 1 k $\Omega$  Widerstand und dem Rheostaten mit 100 k $\Omega$  Nominalwert. Dadurch lässt sich ein hoher Spannungsabzug von bis zu 3,27 V erreichen. Der minimale Spannungsabzug ist dabei 0,0 V. Da ein Spannungsabzug von 0,0 V allerdings nicht nötig ist, wurde entschieden, einen zusätzlichen Widerstand von 1 k $\Omega$  nach dem Rheostaten einzufügen (siehe Abbildung 4.7 - R<sub>2</sub>). Dadurch wird erreicht, dass auch bei der Einstellung des Rheostaten von 0  $\Omega$ , immer ein Spannungsabzug von 1,65 V vorhanden ist.

Dies hat den Vorteil, dass zum einen ein geringerer Strom fließt und zum anderen die Auflösung des Rheostaten erst bei 1,65 V beginnt und nicht bereits bei 0 V. Dadurch lässt sich der Spannungsabzug genauer einstellen. Abbildung 4.6 zeigt die einzelnen Auflösungsstufen des Rheostaten. Eine besonders gute Auflösung wird hier im oberen Spannungsbereich erreicht.

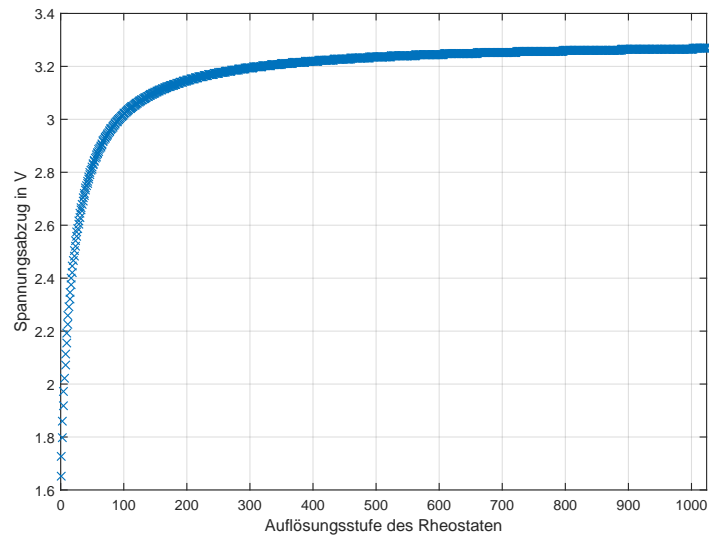


Abbildung 4.6.: Auflösungsstufen des Rheostaten

Die Abbildung 4.7 zeigt die Subtrahierschaltung mit dem zusätzlichen Widerstand hinter dem Rheostaten.

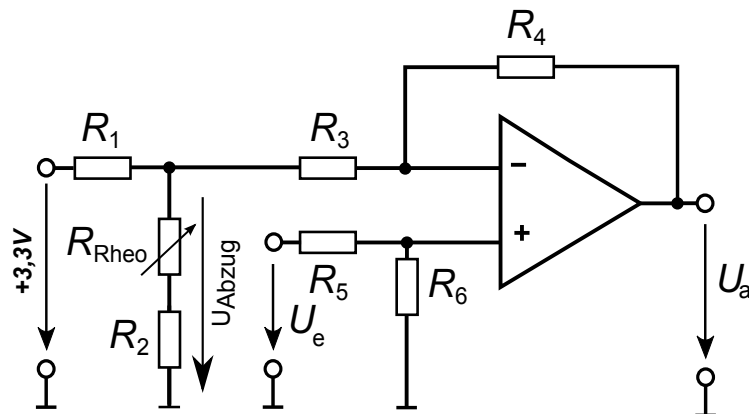


Abbildung 4.7.: Dynamisch einstellbare Subtrahierschaltung mit einem zusätzlichen Widerstand nach dem Rheostaten

Die einstellbaren Spannungen ergeben sich mit dem zusätzlichen Widerstand  $R_2$  nach den folgenden Gleichungen:

$$U_{\max.} = \frac{R_2 + R_{\text{Rheo.max.}}}{R_1 + R_2 + R_{\text{Rheo.max.}}} \cdot U_{\text{ref.}} = \frac{1 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega} \cdot 3,3 \text{ V} = 3,267 \text{ V} \quad (4.1)$$

$$U_{\min.} = \frac{R_2 + R_{\text{Rheo.min.}}}{R_1 + R_2 + R_{\text{Rheo.min.}}} \cdot U_{\text{ref.}} = \frac{1 \text{ k}\Omega + 0 \Omega}{1 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega + 0 \Omega} \cdot 3,3 \text{ V} = 1,65 \text{ V} \quad (4.2)$$

Der Gleichspannungsabzug lässt sich somit in einem Bereich von  $3,267 \text{ V}$  und  $1,65 \text{ V}$  realisieren.

Für die Dimensionierung der Messverstärker lässt sich die Schaltung in Abbildung 4.8 annehmen.

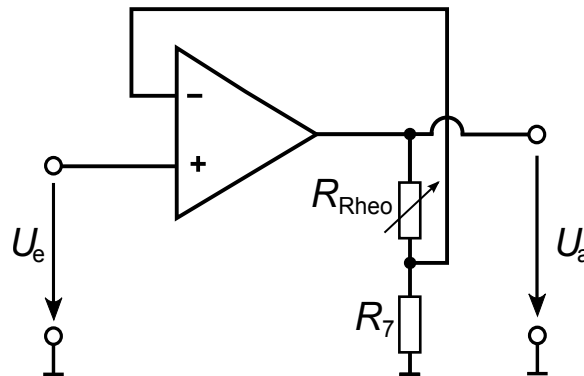


Abbildung 4.8.: Nichtinvertierender Messverstärker

Dabei kommen ein Operationsverstärker, ein Widerstand und ein Rheostat zum Einsatz. Diese Schaltung lässt sich einfach dimensionieren. Aus der Analyse ist bekannt, dass die Verstärkung mindestens den Verstärkungsfaktor 20,34 erreichen muss, um eine Messamplitude von  $3 \text{ mV}$  ausreichend verstärken zu können. Daher wurde entschieden, für die Verstärkerschaltung den Spannungsteiler so zu dimensionieren, dass ein maximaler Verstärkungsfaktor von  $V = 100$  erreicht werden kann. Dazu wird wieder der Rheostat mit dem Nominalwert von  $100 \text{ k}\Omega$  und ein Widerstand mit  $1 \text{ k}\Omega$  gewählt. Dadurch lässt sich die Verstärkung linear zwischen den Verstärkungsfaktoren  $V = 1$  und  $V = 100$  in 1024 Stufen einstellen. Die Grenzen der Verstärkung berechnen sich dabei nach folgenden Gleichungen:

$$V_{\max.} = 1 + \frac{R_{\text{Rheo.max.}}}{R_7} = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = 101 \quad (4.3)$$

$$V_{\min.} = 1 + \frac{R_{\text{Rheo.min.}}}{R_7} = 1 + \frac{0 \Omega}{1 \text{ k}\Omega} = 1 \quad (4.4)$$

Die Abbildung 4.9 zeigt die überarbeitete und dimensionierte analoge Vorverarbeitung mit zusätzlichem Widerstand hinter dem Rheostaten an der Subtrahierschaltung. Die komplette Schaltung besteht nun aus sieben Widerständen, zwei Rheostaten und zwei Operationsverstärkern und kann so auf den neuen Zellsensoren eingesetzt werden.

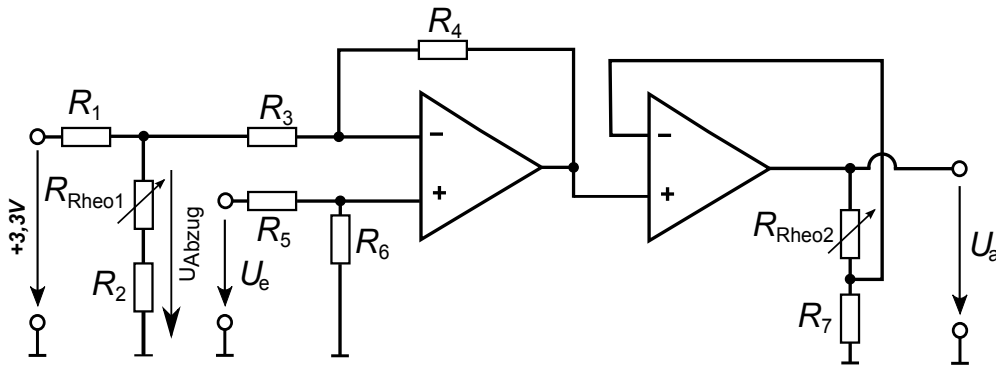


Abbildung 4.9.: Analoge Vorverarbeitung:  $R_1, R_2, R_7 = 1 \text{ k}\Omega$  und  $R_{\text{Rheo1}}, R_{\text{Rheo2}}, R_3 - R_6 = 100 \text{ k}\Omega$

#### 4.2.2. Modifikationen des Schaltungsentwurfs

An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, welche Änderungen sich in der Schaltung des Sensors, im Gegensatz zum vorhergehenden Zellsensor, ergeben haben. So wurden die Bauteilwerte der Anpassungsschaltung des RF-Moduls am eingesetzten Mikrocontroller abgeändert. Ausgetauscht wurden dabei zwei Induktivitäten. Diese Werte ergaben sich aus dem, von Texas Instruments vorgeschlagenen, Anpassungsnetzwerk für den Frequenzbereich bei 434 MHz [32]. Dabei wurden die Induktivitäten L303 und L304 ersetzt (Abbildung 4.10). Im vorhergehenden Sensor war  $L303 = 27 \text{ nH}$  und  $L304 = 47 \text{ nH}$ . Diese wurden nun zu  $L303 = 47 \text{ nH}$  und  $L304 = 51 \text{ nH}$  abgeändert.

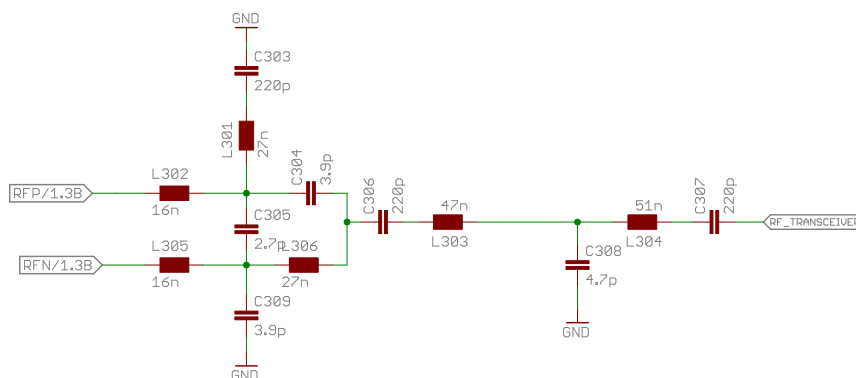


Abbildung 4.10.: Geändertes Anpassungsnetzwerk des CC430F5137

Eine weitere Modifikation der Schaltung ergab sich durch eine Softwareanpassung des Mikrocontrollers. In der Arbeit [48] wurde ein Problem beschrieben, dass die Signalisierung eines ankommenden Burstsignals nur über das Herausführen des demodulierten Signals und wieder Einspeisen in den Mikrocontroller als Interrupt ausgewertet werden kann. Dies konnte durch eine entsprechende Adressierung der Interrupt-Service-Routine (ISR) gelöst werden. Ein Vorteil ergibt sich dabei durch die zwei freiwerdenden Pins, die nun anderweitig genutzt werden können. Das Prinzip der Änderung ist in Abbildung 4.11 dargestellt.

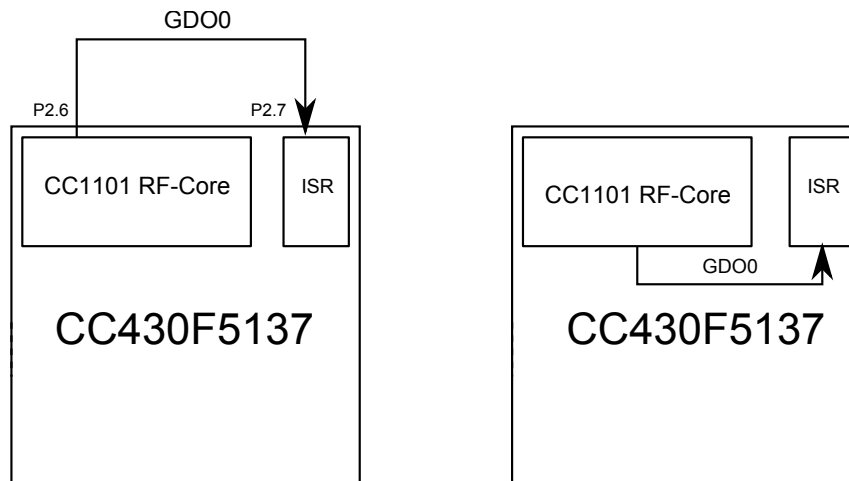


Abbildung 4.11.: Links: externe Interruptauslösung über Ein- und Ausgangeports am Mikrocontroller; Rechts: interne Interruptauslösung durch gezielte Adressierung der Interrupt Service Routine

Des Weiteren konnte ein Fehler an der JTAG-Schnittstelle behoben werden. Dieser Fehler wurde am vorherigen Sensor mittels eines Fädeldrahts korrigiert, um den Mikrocontroller programmieren zu können. Ursache dafür war eine falsch angeschlossene Signalleitung am Mikrocontroller. Die Signalleitung JTAG-Test wurde anstatt an Port 39, an Port 9 angeschlossen. Dies wurde im Redesign des Zellsensors berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde ein Spannungsteiler entfernt, der für die Messung der 3,3 V Versorgungsspannung vorgesehen war. Diese Möglichkeit wurde in der Vergangenheit nicht genutzt und findet auch bei der Impedanzmessung keine Verwendung. Aus Platzgründen wurde deshalb entschieden, diesen zu entfernen.

Eine weitere Änderung ergibt sich durch die geplante Erweiterungsplatine, mit der die hochauflösende Messung realisiert werden soll. Dazu muss der Anschlussstecker abgeändert werden, der die Platine und den Zellsensor miteinander verbinden soll. Näheres dazu in Abschnitt 4.3.



Die Änderungen im Schaltungsentwurf umfassten die folgenden Punkte:

- Bauteilwerte des Anpassungsnetzwerks geändert
- GDO0 Interrupt-Signalisierung intern adressiert
- JTAG-Schnittstellenfehler behoben
- Entfernung der 3,3 V Spannungsmessung
- Änderung des Anschlusssteckers für die Erweiterungsplatine

Die restlichen Schaltungen konnten vom vorhergehenden Zellsensor übernommen werden. Die Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die eingesetzten IC-Bauelemente auf dem Zellsensor.

Tabelle 4.1.: Tabelle der eingesetzte IC-Bauelemente

	Bauteil	Bezeichnung	Hersteller
Steuerung	Mikrocontroller	CC430F5137	Texas Instrumens
analoge Vorverarbeitung	Operationsverstärker	OPA2344	Texas Instrumens
analoge Vorverarbeitung	Rheostat	AD5270-100	Analog Devices
Spannungsversorgung	BoostConverter	TPS61201	Texas Instrumens
RF-Design	Wake-Up Receiver	AS3930	AMS
RF-Design	Antennenumschalter	ADG918	Analog Devices
Temperaturmessung	Temperatursensor	TMP102	Texas Instrumens

Die nachfolgende Abbildung 4.12 gibt einen Überblick über die Verbindungen der einzelnen Funktionskomponenten.

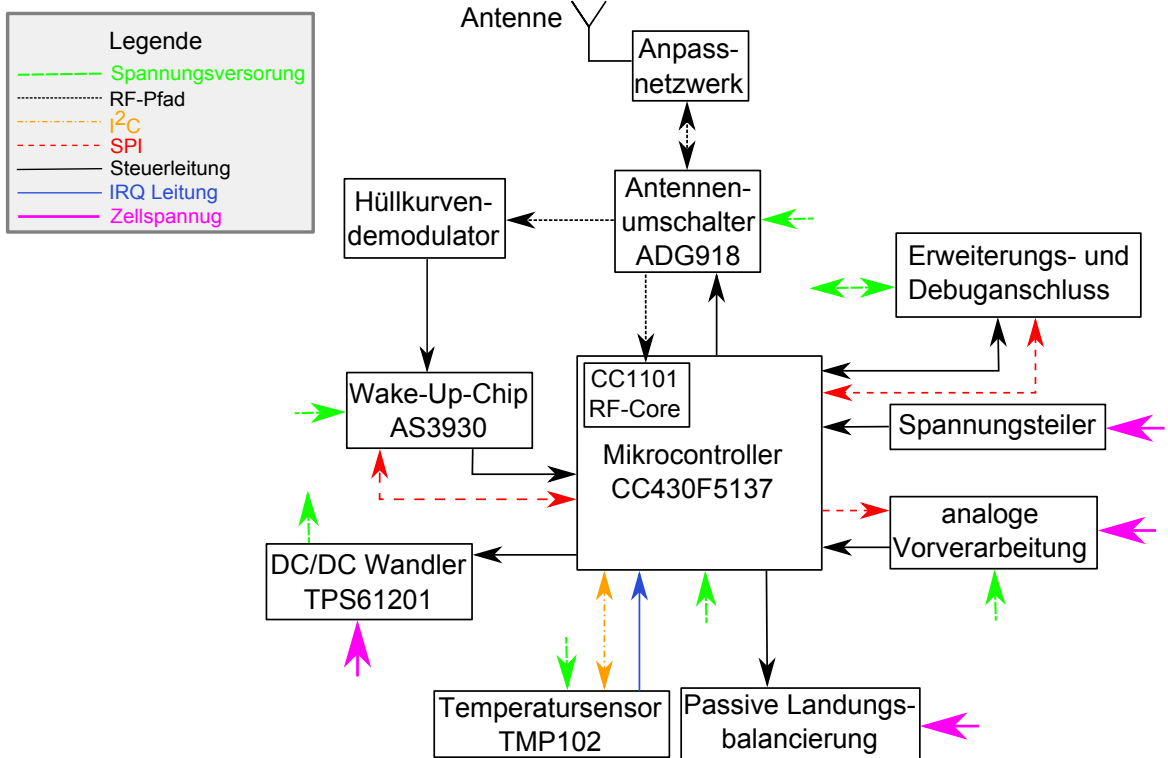


Abbildung 4.12.: Blockschaltbild des neu entwickelten Zellsensors

### 4.2.3. Mechanische- und elektrische Verbindung zwischen Zellsensor und Batteriezelle

Die mechanische- und elektrische Verbindungsfläche an den Platinen dient dazu, den Zellsensor auf dem Gehäuse einer ECC-LFPP 45Ah LiFePO<sub>4</sub>-Zelle zu montieren und elektrisch zu Verbinden. Dieser Anschluss wurde bereits in der Arbeit [62] auf dem Zellsensor realisiert. Dimensioniert wurde die Verbindungsfläche für eine direkte Montage auf den Batteriezellen. Zwischenzeitlich wurde ein Befestigungsadapter entworfen, der die nötige Verbindungsfläche, die der Zellsensor aufweisen muss, wesentlich verkleinert hat. In Abbildung 4.13 ist die bisher vorhandene Verbindungsfläche mit der nun nötigen Kontaktfläche gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass nun nicht mehr eine Kontaktfläche von  $\varnothing= 22\text{ mm}$  vorhanden sein muss. Durch den Befestigungsadapter reicht nun eine verkleinerte Verbindungsfläche von  $\varnothing= 11\text{ mm}$  aus.

Weitere Details über den Befestigungsadapter und die Zellmontage sind im Anhang G zu finden.

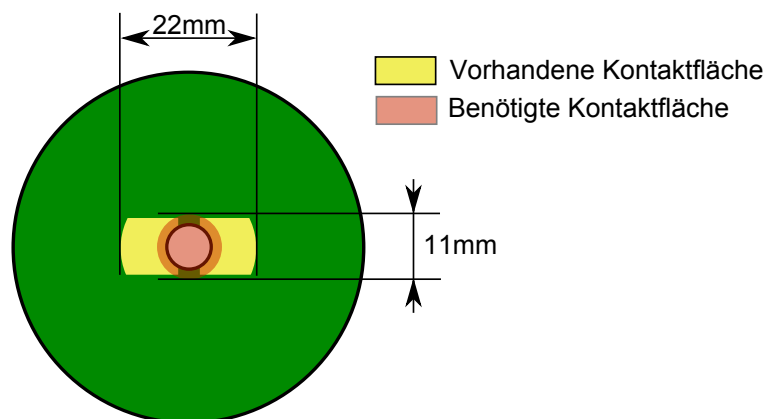


Abbildung 4.13.: Zu überarbeitende Kontaktfläche auf dem Zellsensor: Gegenüberstellung der vorhandenen Kontaktfläche zu der benötigten Kontaktfläche

#### 4.2.4. Platinenlayout des Zellsensors

Durch das Einfügen der analogen Vorverarbeitung, der Änderung von Schaltungen sowie der Anpassung der Kontaktfläche ist es nötig, ein neues Layout des Zellsensor zu erarbeiten. Bei der Erstellung des Layouts wurde besonders auf das richtige Design der Hochfrequenzkomponenten geachtet. Aus den Erfahrungen der vergangenen Arbeiten war bekannt, dass das Design und die Platzierung der Bauteilkomponenten erheblichen Einfluss auf die Abstrahleigenschaften der Schleifenantenne haben kann.

Für das Layout wurden neben den Spezifikationen des PCB-Herstellers, eigene Designregeln festgelegt, die beim Platinenlayout einzuhalten sind.

- Es soll darauf geachtet werden, dass Bauelemente die zu einer Funktionsgruppe gehören, möglichst nahe beieinander liegen.
- Die Blockkondensatoren an den Versorgungsleitungen sollen so nah wie möglich an die entsprechenden IC gelegt werden. Beim Einsatz mehrerer Blockkondensatoren an einer Versorgungsleitung und einem IC ist darauf zu achten, dass die kleinere Kapazität sich näher am IC befindet.
- Die Leiterbahnbreite ist so zu dimensionieren, dass die Signal- und Versorgungsleitungen breit genug sind, um das Signal bzw. den Strom zu führen. Grundsätzlich ist die Leiterbahn so breit wie möglich zu dimensionieren, vorausgesetzt es werden damit keine anderen Komponenten bzw. die HF-Eigenschaften gestört.
- Der Pfad vom Anschluss der Batteriezelle an den Zellsensor über die analoge Vorverarbeitung bis zum AD-Wandler des Mikrocontrollers, soll so kurz wie möglich aufgebaut werden.
- Beim Layout der Signal- und Versorgungsleitungen ist eine parallele Leitungsführung zur Schleifenantenne, die eine Länge von ungefähr  $\lambda/2$  aufweisen, zu vermeiden.
- Das Layout des HF-Anpassungspfads soll nach dem, vom Texas Instruments vorgeschlagenen Layout, aufgebaut werden [32].

Basierend auf diesen Designregeln kann ein Layout des Zellsensors erstellt werden. Um die Abstrahleigenschaften der Schleifenantenne zu bestimmen, wird eine FEM-Simulation des gesamten Platinenlayouts mit CST Microwave Studio durchgeführt. Dabei soll hauptsächlich der Einfluss von Leiterbahnen auf die Abstrahleigenschaften der Schleifenantenne untersucht und verbessert werden. Eine ausführliche Beschreibung der Simulation in CST Microwave Studio und der daraus resultierenden Ergebnisse wird im Anhang C gezeigt. Ergebnis dieser Simulation ist, dass einzelne Leiterbahnen verändert werden müssen. Besonders lange Versorgungsleitungen im Bereich von  $\lambda/2$  der Sende- und Empfangsfrequenz von 434 MHz zeigen sich als problematisch hinsichtlich ihres Einflusses auf die Abstrahlei-

genschaften. Die Länge von  $\lambda/2$  erstreckt sich hier im Bereich von ca. 16,29 cm und fällt somit in die Länge einiger Versorgungsleitungen auf dem Zellsensor.

$$\lambda/2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{c_0}{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{300 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{434 \cdot 10^6 \text{ Hz}} \cdot \frac{1}{\sqrt{4,5}} = 16,29 \text{ cm} \quad (4.5)$$

Durch die Simulation konnten einige Leiterbahnen identifiziert werden, die die Abstrahleigenschaften der Schleifenantenne beeinflussen. Diese wurden dann durch das Einbringen einer Induktivität für hochfrequente Signale unterbrochen.

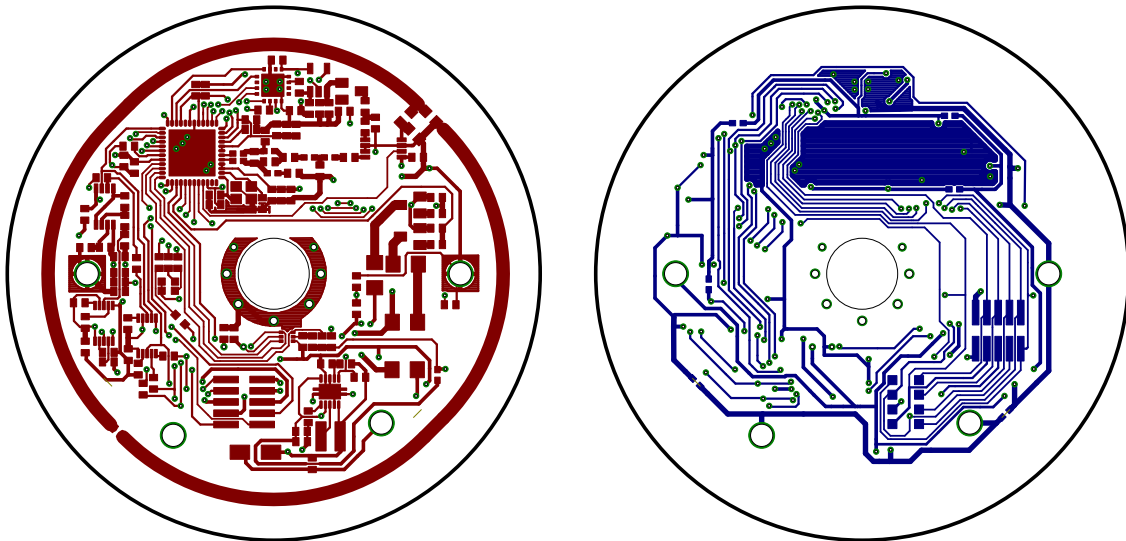


Abbildung 4.14.: Layout des neuen Zellsensors: Links: Layout der Oberseite. Rechts: Layout der Rückseite. Layout in höherer Auflösung in Anhang K.

In der Abbildung 4.14 ist zu sehen, dass die mechanische- und elektrische Kontaktfläche soweit überarbeitet wurde, dass nur noch der in Abschnitt 4.2.3 gezeigte Anschlussbereich an der Oberseite bestehen bleibt. Diese Fläche reicht aus, um den Sensor mit dem Befestigungsadapter zu montieren.

Das Design der äußeren Schleifenantenne bleibt unverändert. Wie auch die rechts und links, auf mittlerer Höhe, liegenden zusätzlichen Spannungsversorgungs-Anschlüsse. Des Weiteren wurde die Position des Nadeladapter-Programmierspins beibehalten, welche sich auf der Unterseite des Zellsensors befinden. Gefertigt wird der Zellsensor als zweilagige Platine mit einer Kupferdicke von  $35\mu\text{m}$ . Die Substrathöhe des Platinenmaterials, beträgt dabei 1,6 mm.

### 4.3. Hochauflösende AD-Wandler-Erweiterungsplatine

In die Schaltungsentwicklung ist auch, ist die Entwicklung der Erweiterungsplatine für die hochauflösende AD-Wandler Messung eingeflossen. Dabei kommt der in der Analyse ausgewählte AD-Wandler AD7691 von Analog Devices zum Einsatz. Das zu messende Signal wird dabei mit einem differentiellen Treiber (Linear Technology LTC6362) an den AD-Wandler herangeführt. Ebenfalls befindet sich die komplette analoge Vorverarbeitungsschaltung auf der Erweiterungsplatine. Es besteht also die Möglichkeit der direkten Messung mittels des hochauflösendem AD-Wandlers sowie der Aufbereitung des Signals durch die analoge Vorverarbeitung.

Es wurden neben der SPI-Schnittstelle, drei benötigte Chip-Select Signalleitungen, eine 3,3 V Spannungsversorgung und zwei frei programmierbare Ein- und Ausgänge vom Mikrocontroller des Zellsensors auf die Erweiterungsplatine geführt. Diese dienen als optionale Testpins, da auf dem Zellsensor selber aus Platzgründen keine Test- bzw. Messpins vorgesehen wurden. Dazu wurde der Anschlussstecker für die Erweiterungsplatine von einem 8-poligen auf einen 10-poligen Stecker abgeändert. Die Pinbelegung des Verbindungssteckers kann aus dem zugehörigen Schaltplan im Anhang J entnommen werden. Abbildung 4.15 zeigt das Layout der hochauflösenden AD-Wandler-Erweiterungsplatine.

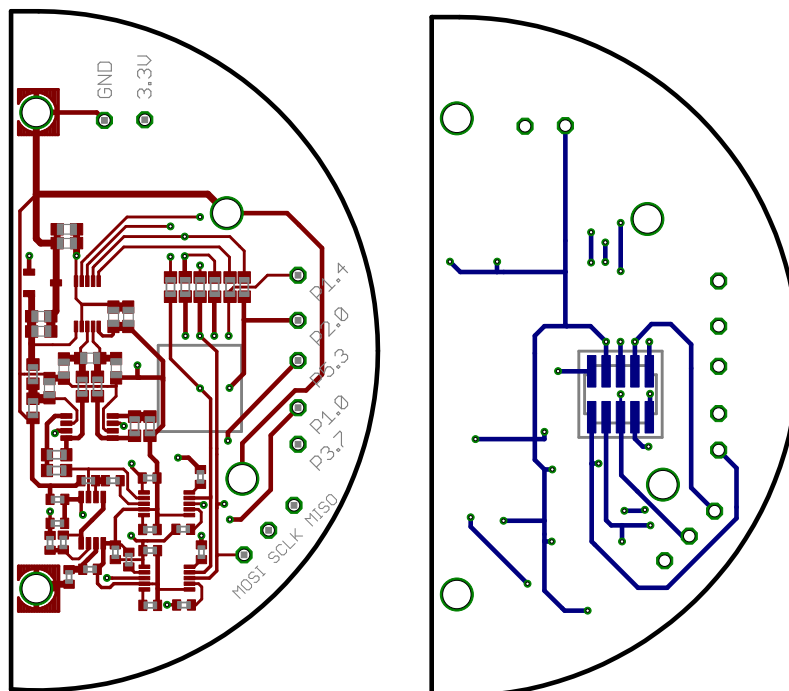


Abbildung 4.15.: Layout der hochauflösenden AD-Wandler-Erweiterungsplatine  
Links: Layout der Oberseite. Rechts: Layout der Rückseite

# 5. Softwareentwurf des Messsystems

In diesem Kapitel werden die Softwarefunktionen des Messsystems vorgestellt. Es wird intensiv auf die Funktionen eingegangen, die für die Impedanzspektroskopie wichtig sind. Für die weiteren Funktionalitäten des Zellsensors und des Batteriesteuergeräts, die für die Messung der Impedanzspektroskopie nicht relevant sind, wird an dieser Stelle auf die Arbeiten [62] und [14] verwiesen. Darin werden die grundlegenden Softwarefunktionen für das Batteriesteuergerät und den Zellsensor erläutert, welche in Tabelle 5.1 aufgelistet sind. Diese Funktionen wurden für das Batteriesteuergerät und den Zellsensor übernommen.

Tabelle 5.1.: Funktionsübersicht Zellsensor v0.4

Zellsensorfunktionen	Zellsensor v0.4
Konfiguration des ZS durch die BS	✓
einzelne Spannungsmessung	✓
Temperaturmessung durch TMP102	✓
Temperaturmessung durch MSP430	✓
Ladungsbalancierung	✓
Adressierbares Wake-Up	✓
Burstmessung	✓

## 5.1. Zellsensor Software

Beim Softwareentwurf des Zellsensors geht es hauptsächlich um Funktionen, die für die Impedanzspektroskopie wichtig sind. Dabei muss zunächst die Steuerung der analogen Vorverarbeitung realisiert werden. Ebenso soll eine dynamische Laufzeitermittlung auf Seiten des Zellsensors sowie des Batteriesteuergeräts implementiert werden. Eine wichtige Implementierung stellt die des Goertzel-Algorithmus dar, welche in Kapitel 5.3 behandelt wird. Zunächst wird aber auf die Speicheroptimierung auf der Seite des Zellsensors eingegangen.

### 5.1.1. Speicheroptimierung der Messwerte

Die Anzahl der aufgenommenen Messwerte ist begrenzt durch die Speichergröße des Mikrocontrollers auf dem Zellsensor. Optimal ist eine Aufnahme von möglichst vielen Messwerten, um das zu messende Signal über einen langen Zeitraum hochauflösend abtasten zu können. Mit dem MSP430F235 des Zellsensors v0.2 war die Speicherung von ca. 800 Messwerten möglich [62]. Durch den Wechsel des Mikrocontrollers MSP430F235 auf den CC430F5137 in der Arbeit [48] steht nun der doppelte RAM Speicher von 4 kByte zur Verfügung. Dadurch gelang es, die maximale Aufnahmelänge auf 1.900 Messwerte zu erweitern. Durch eine Optimierung des Speichermanagements lässt sich die Anzahl dieser Werte aber nochmals steigern. Da der Mikrocontroller über eine 16 Bit Architektur verfügt, werden die Messwerte in einem 16 Bit Register abgelegt. Die aufgenommenen Messwerte des internen AD-Wandlers des CC430F5137 sind aber nur 12 Bit lang. So bleiben bei jeder Abspeicherung 4 Bit ungenutzt. Dies entspricht bei 1.900 abgespeicherten Messwerten, 7.600 ungenutzte Bit.

$$1.900 \cdot 4 \text{ Bit} = 7.600 \text{ Bit}$$

Nach einer Optimierung des Speichermanagements, können durch Nutzung dieser ungenutzten Bytes, bis zu 633 weitere Messwerte im Speicher abgelegt werden.

$$\frac{7.600 \text{ Bit}}{12 \text{ Bit/Messwert}} = 633,333 \text{ Messwerte}$$

Somit können bis zu 2.533 12 Bit Messwerte abgespeichert werden. Dies entspricht einer Speichererweiterung von rund 33 %. Diese Speicheroptimierung wird schematisch in Abbildung 5.1 gezeigt.

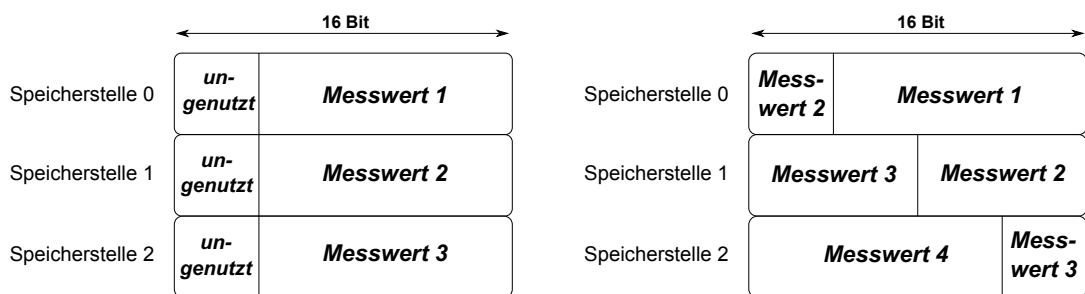


Abbildung 5.1.: Speichermanagement bei 12 Bit Messwerten, Links: Normales Speichermanagement. Rechts: Optimiertes Speichermanagement

Das Speichermanagement wird nun so konfiguriert, dass die Berechnung der richtigen Speicherstelle direkt nach der Wertaufnahme auf dem Zellsensor geschieht. Die Dekodierung erfolgt ebenfalls noch auf dem Zellsensor beim Abruf der Messwerte.



### 5.1.2. Dynamische Laufzeitermittlung

Die dynamische Laufzeitermittlung dient der Messung der Laufzeit eines Signals zwischen Batteriesteuergerät und Zellsensor. Das Konzept dieser Messung entstammt der Ping-Pong-Methode aus [5]. Dabei sendet das Batteriesteuergerät einen Impuls aus, der vom Zellsensor aufgenommen und wieder zurückgesendet wird. Auf Seiten des Batteriesteuergeräts wird die Zeit gemessen, wie lange der Impuls von der Aussendung bis zum Empfang benötigt. Abzüglich der Zeit, die der Zellsensor benötigt um den Impuls zurückzusenden, ergibt sich dadurch die Laufzeit zwischen Batteriesteuergerät und Zellsensor.

$$\text{Laufzeit} = \left( \frac{\text{Wartezeit BS}}{120 \text{ MHz}} \right) - \left( \frac{\text{Verarbeitungszeit ZS}}{16 \text{ MHz}} \right) \quad (5.1)$$

Das Senden und Empfangen des Impulses geschieht, wie auch bei der Burstmessung, über ein kurzzeitiges Abschalten des Trägersignals [62]. Die Messung der Laufzeit auf der Seite des Batteriesteuergeräts übernimmt ein Timer des Mikrocontrollers. Dieser wird mit der Taktrate des Batteriesteuergeräts von 120 MHz getaktet. Somit erhält dieser Timer eine zeitliche Auflösung von 8,33 ns. Auf der Seite des Zellsensors wird die Zeit zwischen empfangen und wieder aussenden des Taktsignals ebenfalls mittels eines Timers gemessen. Dieser wird auf dem Zellsensor mit einer Taktrate von 16 MHz getaktet. Daraus ergibt sich eine zeitliche Auflösung von 62,9 ns, die der Zellsensor messen kann.

Der Zustandsablauf der dynamischen Laufzeitermittlung in Abbildung 5.2 zeigt die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Zuständen. Diese Abhängigkeiten sind jeweils mit den Pfeilen zwischen den Zuständen des Batteriesteuergeräts und des Zellsensors aufgezeigt.

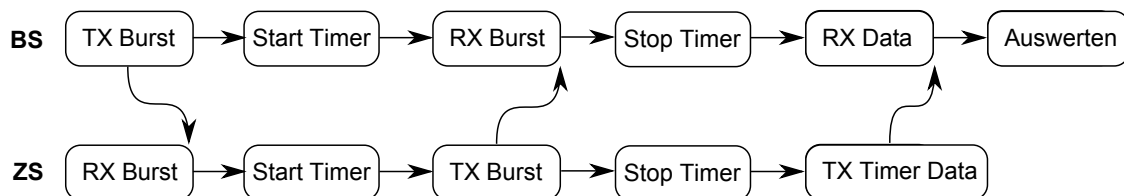


Abbildung 5.2.: Zustandsablauf und Abhängigkeiten der dynamischen Laufzeitermittlung

Da hier eine Messung über zwei unterschiedliche Zeitbasen gemacht wird, kann es zu Fehlmessungen kommen, wenn die Taktrate des Zellsensors nicht die erwarteten 16 MHz beträgt. Um dies zu verhindern, wird eine Taktkalibrierung implementiert, die den Takt des Zellsensors auf die gewünschten 16 MHz einstellen soll. Diese Kalibrierung wird ebenfalls über die Funkschnittstelle realisiert.

### Taktkalibrierung

Ein Vorteil des auf dem Zellsensor eingesetzten Mikrocontrollers CC430F5137 ist, dass sich die DCO-Taktrate während des Betriebs einstellen lässt. Diese Funktion wird hier ausgenutzt, um eine Taktkalibrierung des internen DCO durchzuführen. Dazu sendet der Zellsensor ein Taktsignal mit definierter Pulslänge aus, das vom Batteriesteuergerät empfangen und ausgewertet wird. Anhand der empfangenen Pulslänge des Taktsignals, kann das Batteriesteuergerät Abweichungen des Zellsensortakts erfassen und diese korrigieren.

Das Sendemodul des Mikrocontrollers lässt sich direkt mit einem Timer des Mikrocontrollers verbinden (Abbildung 5.3). Da dieser Timer direkt durch den DCO getaktet wird, lässt sich ein Taktsignal senden, dessen Pulslänge sich in der Abhängigkeit des DCO-Takts verändert.

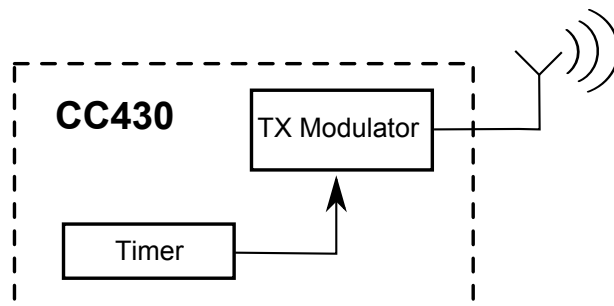


Abbildung 5.3.: Sendeprozess der DCO-Kalibrierung (nach [52])

In Abbildung 5.4 ist das Prinzip dieser Messung dargestellt. Der Zellsensor sendet ein Signal mit einer Periodenlänge von 2 ms aus. Dies entspricht bei einem DCO-Takt von 16 MHz genau 32.000 DCO-Takten. Die Messung durch das Batteriesteuergerät erfolgt jeweils an den steigenden Flanken des Taktsignals.

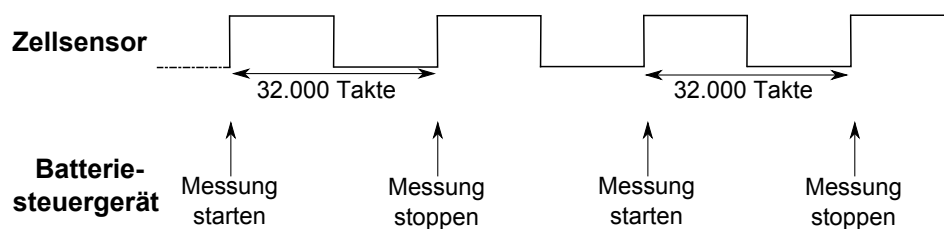


Abbildung 5.4.: Pulsmessung des Batteriesteuergerätes

Die Messung am Batteriesteuergerät ergibt im Idealfall 240.000 Takte. Diese entsprechen bei der 120 MHz Taktung genau 2 ms. Ergibt die Messung am Batteriesteuergerät weniger als 240.000 Takte ist dies ein Anzeichen dafür, dass der Takt des Zellsensors zu schnell ist. Werden mehr als 240.000 Takte gemessen, ist der Zellsensor DCO-Takt zu langsam.

Anhand dieser Messungen können Rückschlüsse auf die DCO-Geschwindigkeit des Zellsensors gezogen und von Seiten des Batteriesteuergeräts entsprechend reagiert werden. Eine Reaktion des Steuergeräts ist es, eine Nachricht an den entsprechenden Zellsensor zu schicken, der daraufhin seinen DCO-Takt verringert bzw. erhöht. Die Messung wird solange wiederholt, bis der Zellsensor DCO-Takt innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs liegt.

Abbildung 5.5 zeigt den schematischen Ablauf dieser Kalibrierung auf der Seite des Batteriesteuergeräts sowie an dem Zellsensor.

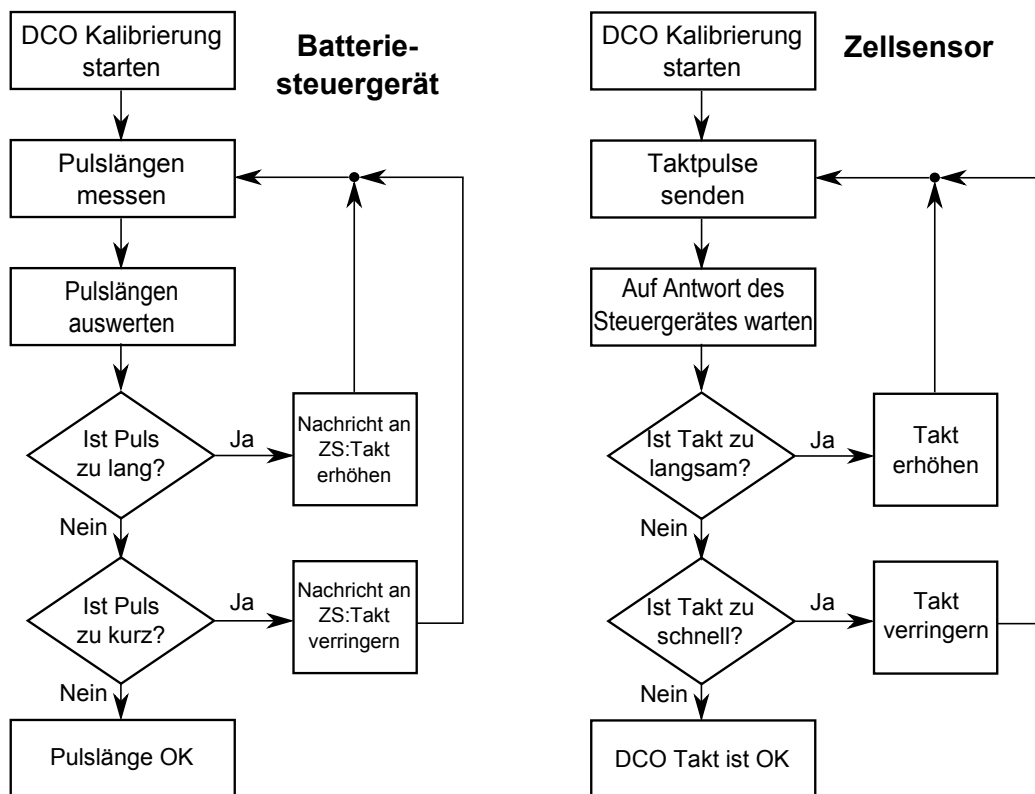


Abbildung 5.5.: Softwareablauf der DCO-Kalibrierung am Zellsensor

### 5.1.3. Steuerung der analogen Vorverarbeitung

Für die Realisierung der Impedanzspektroskopie ist die Steuerung der analogen Vorverarbeitung die wichtigste Softwareerweiterung auf Seiten des Zellsensors. Bei der Steuerung geht es hauptsächlich um die Einstellung der beiden Rheostaten, die zum einen den Gleichspannungsabzug an der Subtrahierschaltung und zum anderen den Grad der Verstärkung des Messsignals einstellen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Arten, wie die analogen Vorverarbeitung gesteuert werden kann. Diese sind die Einstellung unter Last und die Einstellung mittels der Messung des Gleichspannungsanteils.

#### Einstellung durch Messung des Gleichspannungsanteils

Für die Einstellung durch Messung des Gleichspannungsanteils wird der zusätzliche AD-Wandler Kanal verwendet, der bereits in Abbildung 4.5 auf Seite 96 gezeigt wurde. Dabei wird der Gleichspannungsanteil der Zellspannung über den Spannungsteiler gemessen. Aus dem gemessenen Gleichspannungsanteil lassen sich die Einstellungen für die Subtrahierschaltung sowie für die Spannungsverstärkung berechnen, wie es Abbildung 5.6 zeigt.

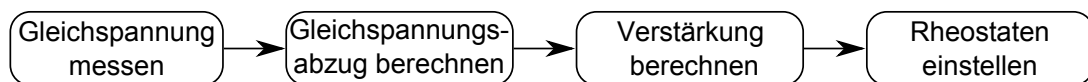


Abbildung 5.6.: Softwareschritte zur Einstellung mittels Gleichspannungsanteil

Ein Nachteil dieser Einstellungsmethode ist es, dass die Stärke der Anregung und somit die Höhe der Messamplitude nicht bekannt ist. Dadurch ist eine korrekte Berechnung der Verstärkung nicht möglich, sondern kann nur abgeschätzt werden. Ist die Messamplitude zu hoch, kann es vorkommen, dass die Messspannung soweit verstärkt wird, dass diese über den Referenzspannungsbereich des AD-Wandlers hinaus verstärkt wird und somit in die Begrenzung gerät.

## Einstellung unter Last

Eine präzisere Art die analoge Vorverarbeitung einzustellen ist es, diese unter Last vorzunehmen. Dabei wird die Spannung über den Pfad der analogen Vorverarbeitung gemessen und ausgewertet. Bei dieser Einstellungsmethode wird die zu vermessende Batteriezelle mit einem Wechselstromanteil von 50 Hz angeregt. Durch diese Anregung und der daraus resultierenden Messamplitude kann der richtige Wert für den Gleichspannungsabzug sowie für die Verstärkung ermittelt werden. Bei der Einstellung der analogen Vorverarbeitung kann in zwei verschiedenen Stufen unterschieden werden.

1. Kompensierung der Gleichspannung
2. Verstärkung der Messspannung

### Erste Stufe: Kompensierung der Gleichspannung

Die Kompensierung der Gleichspannung erfolgt dabei schrittweise. Der Rheostat wird langsam erhöht um einen höheren Spannungsabzug durch die Subtrahierschaltung zu erwirken. Dies geschieht solange, bis eine einstellbare untere Grenzspannung erreicht wird. Abbildung 5.7 zeigt das Ablaufschema dieser Einstellung.

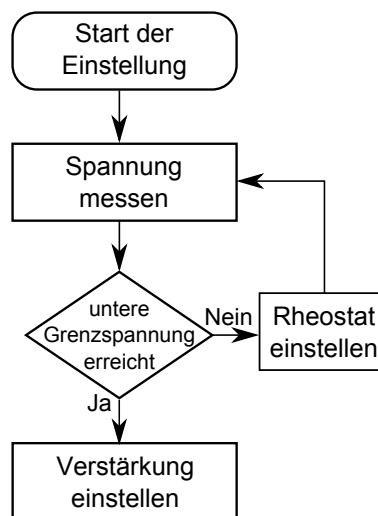


Abbildung 5.7.: Erste Stufe der analogen Vorverarbeitung: Gleichspannung abziehen

Bei dem Abzug der Gleichspannung kommt es nicht auf ein genaues Erreichen der vorgegebenen Grenzspannung an. Wichtig ist nur, dass ein größtmöglicher und stabiler Spannungsabzug erreicht wird. Der Wert des erfolgten Spannungsabzugs ist für die Berechnung des Impedanzspektrums sowie für die weitere Verstärkung nicht notwendig.

### Zweite Stufe: Verstärkung der Messspannung

Nachdem der Gleichspannungsanteil auf die untere Grenzspannung reduziert wurde, kann die Messspannung verstärkt werden. Die Verstärkung geschieht hier, wie bei der ersten Stufe, durch eine schrittweise Erhöhung des Rheostaten an der Verstärkerschaltung. In Abbildung 5.8 ist auch das Ablaufschema der zweiten Stufe dargestellt. Es unterscheidet sich zu der ersten Stufe lediglich darin, dass hier eine obere Grenzspannung erreicht werden soll.

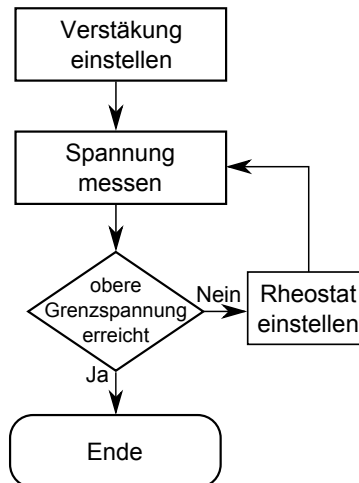


Abbildung 5.8.: Zweite Stufe der analogen Vorverarbeitung: Messwert verstärken

Bei der Verstärkung ist es nun wichtig, dass die richtige Frequenz von 50 Hz für die Anregung gewählt wird. Grund hierfür ist, dass das Messsignal 20 ms lang mit 1 kHz abgetastet wird. Dabei wird nach dem größten Amplitudenwert gesucht, nach dem entschieden wird ob die obere Grenzspannung erreicht worden ist. Wird eine langsamere Frequenz gewählt, kann es vorkommen, dass innerhalb dieser 20 ms nicht der höchste Amplitudenwert abgetastet wird, und somit die Verstärkung falsch eingestellt wird. Eine Fehleinstellung der Verstärkung lässt sich daran erkennen, dass ein Teil der Amplitude außerhalb des Referenzbereichs des AD-Wandlers liegt, und somit nicht erfasst werden kann. Abbildung 5.9 zeigt die Abtastung eines Messsignals bei 50 Hz sowie bei 25 Hz.

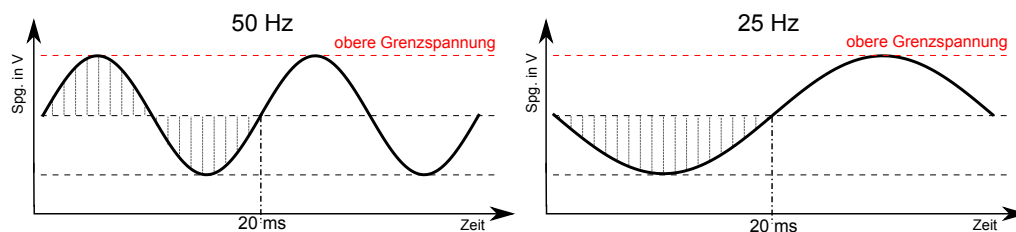


Abbildung 5.9.: Möglicher Fehler der Messwert-Verstärkung. Links: Abtastung eines 50 Hz Messsignals. Rechts: Worst-Case Abtastung eines 25 Hz Messsignals.

Eine längere Aufnahme des Messsignals ist zwar möglich, würde aber die gesamte Einstellzeit enorm verlängern. Die Abbildung 5.9 zeigt bei dem 25 Hz Signal den "Worst-Case" Fall, indem die Perioden nicht in ihrer vollen Amplitude vermessen werden. Dadurch wird angenommen, dass die obere Grenzspannung noch nicht erreicht ist und das Messsignal noch weiter verstärkt werden kann. Dieser Fehler kann durch die Wahl der richtigen Anregefrequenz vermieden werden.

Nachdem das Messsignal durch die analoge Vorverarbeitung entsprechend aufbereitet wurde, kann es durch den AD-Wandler des Mikrocontrollers gemessen werden. In Abbildung 5.10 sind die einzelnen Stufen der Bearbeitung nochmals dargestellt. In diesem Beispiel wird eine 3,3 V Batteriespannung mit einer Wechselamplitude von 4 mV beaufschlagt. Der Spannungsabzug der Subtrahierschaltung (1. Stufe) zieht die maximale Spannung von 3,276 V ab. Die 2. Stufe verstärkt die Messamplitude soweit, dass die obere Grenzspannung von 2,4 V erreicht wird.

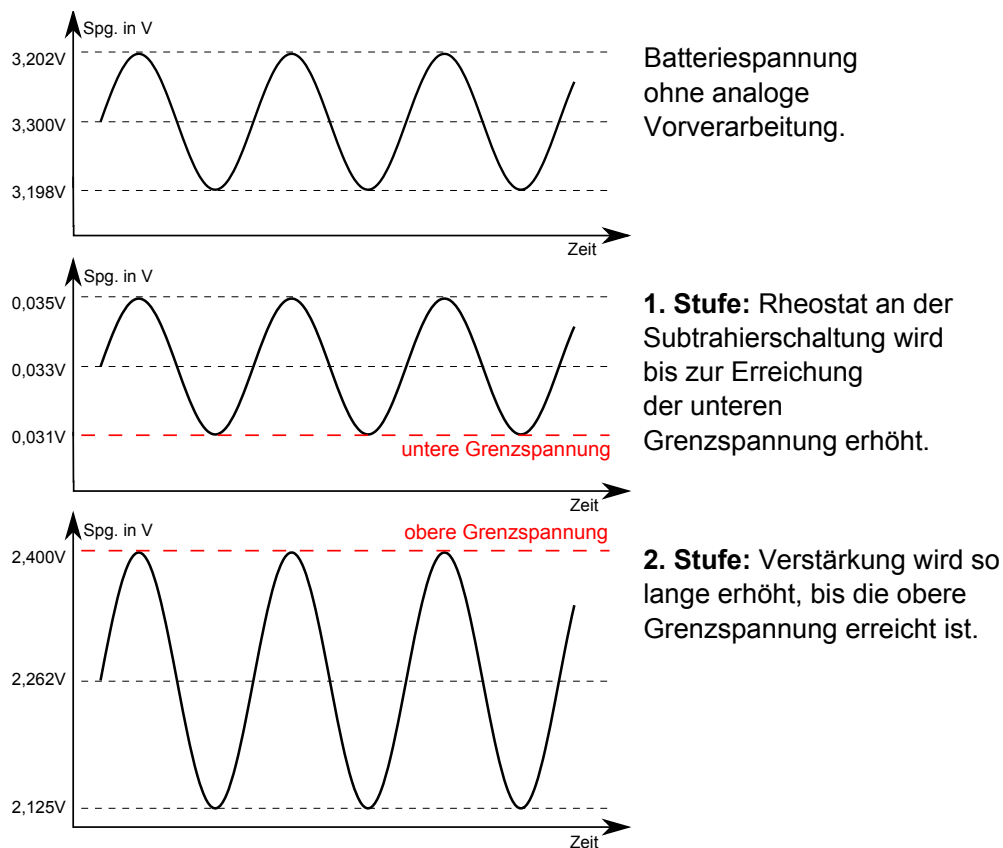


Abbildung 5.10.: Konzeptdarstellung der verschiedenen Stufen mit Grenzspannungen der Einstellung unter Last

Das ursprüngliche Messsignal von 4 mV erreicht nach der analogen Vorverarbeitung einen

Amplitudenwert von 275 mV und kann somit vom internen 12 Bit AD-Wandler erfasst werden. Die Verstärkung beträgt in diesem Fall  $V = 68,75$ .

## 5.2. Batteriesteuergerät Software

An dieser Stelle wird das grundlegende Softwarekonzept des Batteriesteuergeräts erläutert. Es soll ein Überblick über die Funktionen und die Arbeitsweise des Batteriesteuergeräts gegeben werden. Die Software musste aufgrund der Neuentwicklung komplett neu erarbeitet werden. Es wurde versucht, die einzelnen Funktionen des alten Steuergeräts aus den Arbeiten [14] und [62] zu übernehmen.

Die Steuerung soll wie beim Vorgängermodell über einen externen PC erfolgen. Dies kann durch die vorhandene UART-Schnittstelle realisiert werden. Die softwareseitige Abarbeitung von Aufgaben soll in verschiedene Zustände unterteilt werden. Dazu werden die einzelnen Funktionen modular aufgebaut. Dies bedeutet, dass Funktionsmodule weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten können. So lässt sich eine bessere Wartung und Funktionsüberprüfung der Software realisieren.

Die Software wird in einem Automatenmodell realisiert. Die grundlegende Softwarestruktur des Batteriesteuergeräts ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Es handelt sich um eine Endlosschleife, die durch Interrupts, wie der von der UART-Schnittstelle, unterbrochen werden kann. Einzelne Aufgaben werden in Unterautomaten abgearbeitet. Die Zuteilung in die einzelnen Unterautomaten, erfolgt durch die UART-Auswertung. Nach der Abarbeitung des Unterautomaten, geht die Software wieder in die Endlosschleife und wartet auf eine weitere Unterbrechung durch einen Interrupt.

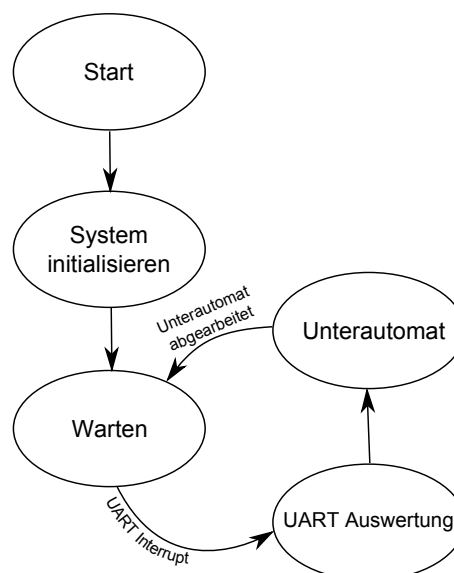


Abbildung 5.11.: Grundautomat des Batteriesteuergeräts



Da der Ablauf des Softwarekonzepts des Batteriesteuergeräts Interrupt gesteuert ist, müssen die Prioritäten an die verschiedenen Interrupts vergeben werden. Die Einteilung der einzelnen Prioritäten erfolgt, wie in Abbildung 5.12 zu sehen, nach der zulässigen Latenzzeit der vom Interrupt gesteuerten Funktion. So sind alle zeitkritischen Funktionen, wie Delay- und Timeout-Zeiten mit einer hohen Priorität zu versehen, damit diese rechtzeitig abgearbeitet werden können. Nicht zeitkritische Funktionen, wie die UART Kommunikation, bekommen eine niedrige Priorität.

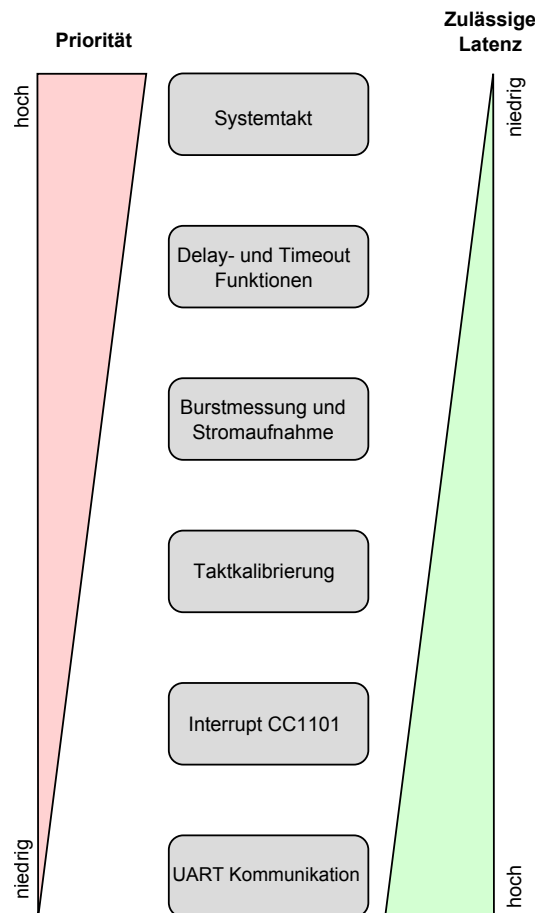


Abbildung 5.12.: Prioritätenverteilung am Batteriesteuergerät

### 5.2.1. Funktionsübersicht des Batteriesteuergeräts

In diesem Abschnitt wird auf die Funktionen des neu entwickelten Batteriesteuergeräts eingegangen. Weitestgehend sind diese Funktionen aus dem vorangegangenen Steuergerät übernommen worden, weshalb hier nur die wichtigsten Funktionen kurz erwähnt werden. Im Anhang F.1 befindet sich eine Befehlsliste, mit der die einzelnen Befehle ausgeführt

werden können.

### **Aufnahme von einzelnen Spannungswerten**

Zur Messung einzelner Spannungen, lässt sich ein adressierter Befehl senden, der eine einzelne Spannungsmessung auf einem Zellsensor auslöst. Der Sensor schickt die Daten der aufgenommenen Spannung anschließend automatisch wieder an das Batteriesteuergerät zurück.

### **Burstmessung durchführen**

Zum Start der Burstmessung kann ein Befehl gesendet werden, der als Broadcast-Message an alle Zellsensoren geht. Dabei ist die gewünschte Abtastfrequenz und die Anzahl der aufzunehmenden Werte anzugeben. Details dazu sind in [62] zu finden.

### **Abruf von Spannungswerten der Burstmessung**

Das Abrufen von Spannungswerten der Burstmessung lässt sich durch einen Befehl ausführen. Dieser wird adressiert an einen Zellsensor gesendet. Der angesprochene Zellsensor antwortet daraufhin und sendet die aufgenommenen Spannungsdaten in einzelnen Paketen zurück an das Batteriesteuergerät. Details dazu sind in [62] zu finden.

### **Abruf der Goertzel DFT-Werten**

Um die, durch den Goertzel-Algorithmus berechneten DFT-Werte, der bei der Burstmessung erfassten Spannungswerte zu erhalten, ist ein Befehl vom Batteriesteuergerät zum entsprechenden Zellsensor zu senden. Dabei muss die Anzahl der für die Berechnung verwendeten Perioden, die verwendete Burstfrequenz sowie die Signalfrequenz angegeben angegeben und an den Zellsensor übertragen werden. Also Rückgabewert erhält man dann die komplexen Werte der Spannung sowie des gemessenen Stroms.

### **Manuelle Einstellung der analogen Vorverarbeitung**

Neben der bereits vorgestellten automatischen Einstellung der analogen Vorverarbeitung, wurde auch eine manuelle Einstellung implementiert. Dabei kann man, durch einen adressierten Befehl, dem Zellsensor die einzustellenden Werte für die Rheostaten der analogen Vorverarbeitung senden.

### **Dynamische Laufzeitmessung**

Die bereits vorgestellte dynamische Laufzeitermittlung lässt sich durch einen einfachen adressierten Befehl an dem Batteriesteuergerät auslösen. Als Rückgabewert werden an die UART-Schnittstelle die gemessenen Takte des Batteriesteuergerät sowie des Zellsensors ausgegeben.

### **Konfigurationsdaten eines Zellsensors abrufen**

Eine neue Funktion, die in dieser Arbeit implementiert wurde, ist das Abrufen von Konfigurationsdaten eines Zellsensors. Dazu lässt sich ein adressierter Befehl an den Zellsensor senden. Dieser schickt anschließend seine aktuellen Einstellung an das Steuergerät zurück, die daraufhin über die UART-Schnittstelle ausgegeben werden.

### 5.2.2. Taktaussendung und synchrone Strommessung

Die Taktaussendung und die Strommessung sind die wichtigsten Funktionen des Batterie-steuergärts für die Impedanzspektroskopie. Diese Funktionen sind sehr zeitkritisch, weshalb diese komplett durch Timer-Interrupts gesteuert werden.

Die eigentliche Taktaussendung wurde in der Arbeit [62] entwickelt. Die Neuerung aus dieser Arbeit besteht in der synchronen Messung des Stroms. Dazu wird nach der Taktaussendung eine festgelegte Wartezeit abgearbeitet, bevor die Strommessung durchgeführt wird. Diese Wartezeit wurde in Abschnitt 3.3 zu  $72,2 \mu\text{s}$  bestimmt. Abbildung 5.13 zeigt den Unterautomaten, der diese Funktion realisiert.

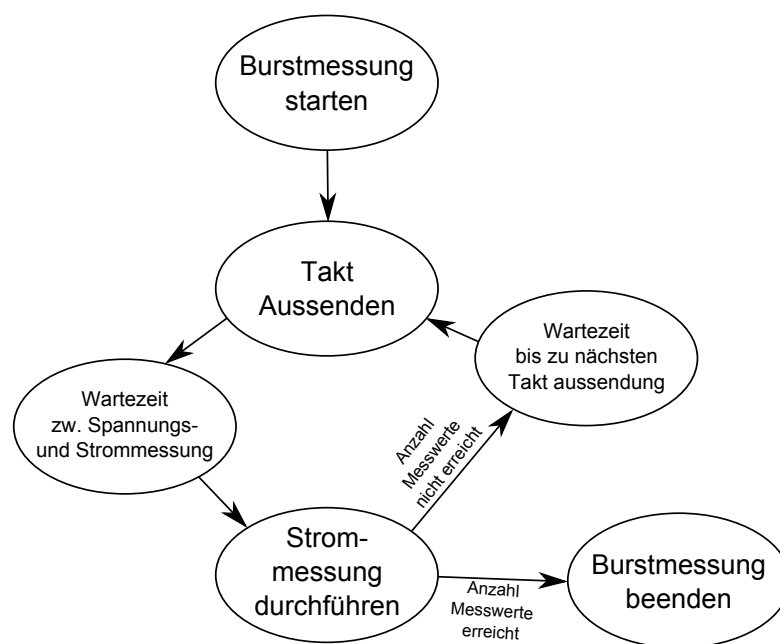


Abbildung 5.13.: Unterautomat der Burstmessung zur Impedanzspektroskopie

Da die Wartezeit zwischen dem Aussenden des Taktes und der Strommessung sehr zeitkritisch ist, wurde eine von Texas Instruments vorgegebene Delay-Funktion<sup>1</sup> verwendet, um die  $72,2 \mu\text{s}$  Wartezeit zu erreichen. Diese Funktion benötigt für die Abarbeitung lediglich drei Taktzyklen [34]. Bei einer Taktung von 120 MHz lässt sich dadurch eine Genauigkeit der Wartezeit von bis zu 25 ns erreichen.

<sup>1</sup>TivaWare Funktion: SysCtlDelay()

### 5.3. Implementierung des Goertzel-Algorithmus

Durch den Einsatz des Goertzel-Algorithmus soll eine zeitintensive Übertragung der Messwerte verhindert werden. Dazu soll der in Kapitel 3.6.3 vorgestellte Algorithmus sowohl im Batteriesteuergerät wie auch auf den Zellsensoren implementiert werden.

Diese Implementierung des Goertzel-Algorithmus wird im Folgenden auf dem Zellsensor beschrieben. Die Implementierung auf dem Batteriesteuergerät ist dieselbe, weshalb darauf nicht weiter eingegangen wird.

#### 5.3.1. Implementierung auf dem Zellsensor

Die Implementierung des Goertzel-Algorithmus erfordert eine effiziente Umsetzung der in Abschnitt 3.6.3 vorgestellten Filterstruktur. Dabei ist besonders auf die begrenzten Ressourcen des Mikrocontrollers zu achten. So müssen für die Berechnung der Real- und Imaginärteile unter anderem Sinus- und Kosinus-Werte berechnet werden. Um diese effizient berechnen zu können, wird ein MSP-Mathematik-Library von Texas Instruments verwendet [33]. Neben dieser Berechnungen müssen vor der eigentlichen Filterberechnung noch einige für die Berechnung wichtige Konstanten vorberechnet werden. Dazu müssen die Abtastfrequenz, die Abtastfrequenz und die Anzahl der in die Berechnung einfließenden Perioden bekannt sein. Diese drei Werte werden dem Zellsensor durch das Steuergerät vor der Berechnung mitgeteilt. Berechnet werden muss zunächst die Konstante  $N$ .

$$N = \frac{\text{Abtastfrequenz } F_s}{\text{Signalfrequenz } f} \quad N \in \mathbb{N} \quad (5.2)$$

Diese Konstante gibt an, bis zu welcher Länge das Filter berechnet werden soll.  $N$  bildet sich als Quotient aus der Abtastfrequenz  $F_s$  und der Signalfrequenz  $f$ . Da  $N \in \mathbb{N}$  sein muss, wird ersichtlich, dass das Verhältnis zwischen Abtastfrequenz  $F_s$  und der Signalfrequenz  $f$  passend gewählt werden muss, damit das Filter korrekte Werte berechnen kann. Ist die Abtastfrequenz  $F_s$  nicht ein ganzzahliges Vielfaches der Signalfrequenz  $f$ , kommt es zu Fehlern in der Berechnung der Filterlänge  $N$  und somit zu Fehlern in der errechneten Impedanz.

Eine weitere Konstante die vorberechnet werden kann, ist die Konstante  $k$ . Die Konstante  $k$  bestimmt hierbei die zu detektierende Zielfrequenz [7].

$$k = \left( \frac{\text{Anzahl Abtastpunkte} \cdot \text{Signalfrequenz}}{\text{Abtastfrequenz}} \right) \quad k \in \mathbb{N} \quad (5.3)$$

Des Weiteren lässt sich  $\omega$  berechnen. Dies ist für die Berechnung der Sinus- und Kosinus-Werte nötig:

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot k}{\text{Anzahl Abtastpunkte}} \quad \omega \in \mathbb{R} \quad (5.4)$$

$$\text{sinus} = \sin(\omega) \quad \text{sinus} \in \mathbb{R} \quad (5.5)$$

$$\text{cosine} = \cos(\omega) \quad \text{cosine} \in \mathbb{R} \quad (5.6)$$

Nun kann der nötige Filterkoeffizient  $\text{koeff}$  für den rekursiven Teil des Filters berechnet werden:

$$\text{koeff} = 2 \cdot \text{cosine} \quad \text{koeff} \in \mathbb{R} \quad (5.7)$$

Mit diesen Vorberechnungen kann nun mit der eigentlichen Filterberechnung begonnen werden. Berechnet wird das Filter bis zu einer Länge von  $N+1$ . Da im Schritt  $N+1$  kein Wert mehr vorhanden ist, wird der Wert Null in die Filterstruktur geschoben. Berechnet werden im rekursiven Teil des Filters (Abbildung 5.14) die Verzögerungsstufen  $b_n$ ,  $b_{n-1}$  und  $b_{n-2}$  bis zu der Stelle  $N$ . Der nicht-rekursive Teil des Filters wird bis zur Stelle  $N$  nicht berechnet. Die einzelnen Verzögerungsstufen berechnen sich dabei wie folgt:

$$b_n = \text{koeff} \cdot b_{n-1} - b_{n-2} + x[n] \quad b_n \in \mathbb{R} \quad (5.8)$$

$$b_{n-2} = b_{n-1} \quad b_{n-2} \in \mathbb{R} \quad (5.9)$$

$$b_{n-1} = b_{n-2} \quad b_{n-1} \in \mathbb{R} \quad (5.10)$$

Hier wird deutlich, dass bis zur Stelle  $N$ , lediglich  $N$  Multiplikationen sowie  $2 \cdot N$  Additionen bzw. Subtraktionen benötigt werden. Der rekursive Teil des Filters ist in Abbildung 5.14 Rot markiert zu sehen. In diesem Teil werden die Berechnungen bis zum Wert  $N$  durchgeführt.

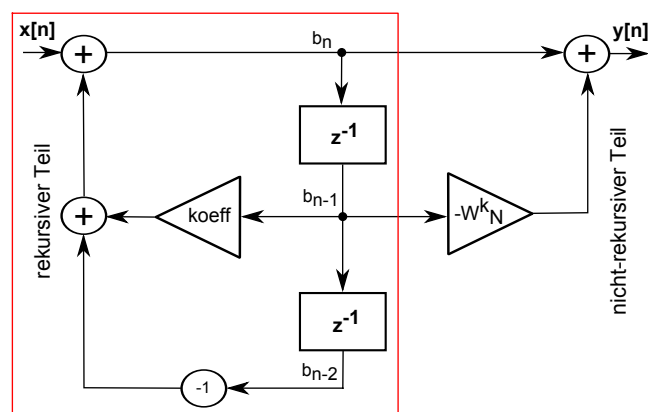


Abbildung 5.14.: Berechnung des rekursiven Filterteils

Lediglich im letzten Berechnungsschritt  $N+1$  wird der nicht-rekursive Teil (Abbildung 5.15) des Filters berechnet.

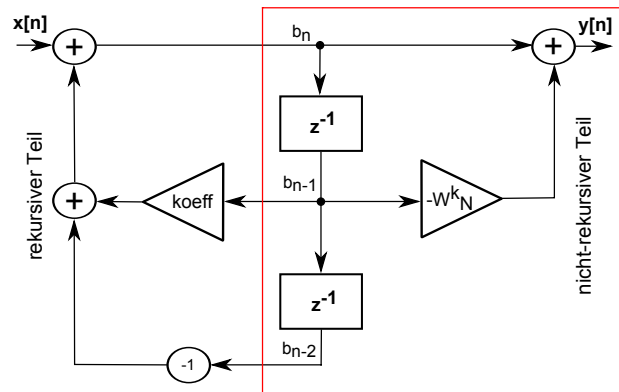


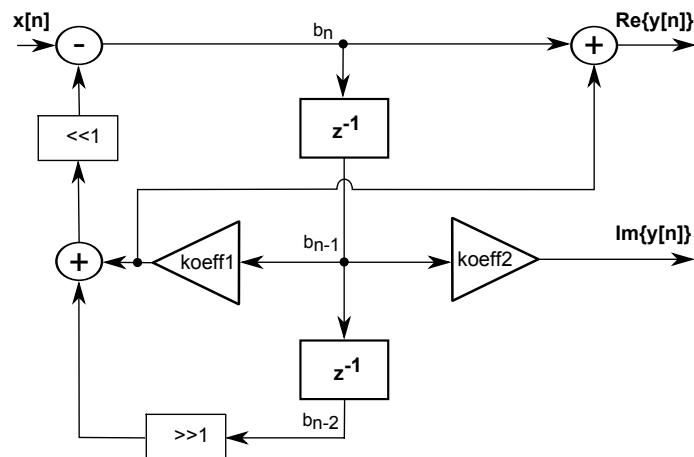
Abbildung 5.15.: Berechnung des nicht-rekursiven Filterteils

Da es hier zu einer komplexer Multiplikation kommt, muss für den letzten Berechnungsschritt die Struktur des Filters für die Implementierung auf dem Mikrocontroller optimiert werden. Diese optimierte Form zeigt Abbildung 5.16. Dabei werden neben der Filterstruktur auch die Koeffizienten für den rekursiven und den nicht rekursiven Teil des Filters geändert. Diese ergeben sich nun zu [64]:

$$\text{coeff1} = -\cos(\omega) \quad (5.11)$$

$$\text{coeff2} = \sin(\omega) \quad (5.12)$$

Die für den Berechnungsschritt  $N+1$  optimierte Filterstruktur ist in Abbildung 5.16 zu sehen.

Abbildung 5.16.: Für die Mikrocontroller-Implementierung optimierte Filterstruktur des Berechnungsschritts  $N+1$  (nach [64])

Die Differenzgleichung des für die Implementierung optimierten Filters ergibt sich nun zu:

$$b_n = x[n] - b_{n-2} + 2 \cdot \cos(\omega) \cdot b_{n-1} \quad (5.13)$$

Aus dieser Gleichung lässt sich der Real- und Imaginärteil wie folgt berechnen [64]:

$$\text{Re}[N] = b_{n1} - b_{n2} \cdot \cos(\omega); \quad (5.14)$$

$$\text{Im}[N] = b_{n2} \cdot \sin(\omega); \quad (5.15)$$

Diese Rechnungen lässt sich nun auf dem Mikrocontroller implementieren, da sie nur noch aus vorberechneten Werten, reellen Additionen und reellen Multiplikationen bestehen.

### 5.3.2. Test der implementierten Filterstruktur

Um die entwickelte Filterstruktur zu testen, wird ein Strom- und Spannungssignal aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Sinussignal mit 250 Hz, welches mit 4 kHz abgetastet wird. Um eine Bewertung des implementierten Goertzel-Filters vornehmen zu können, werden die Messwerte einmal durch die von Matlab gegebene FFT- sowie der Matlab-Goertzel Funktion berechnet. Diese Werte können nun mit den Ergebnissen des implementierten Goertzel-Algorithmus verglichen werden. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 5.2.

Tabelle 5.2.: Vergleich der entwickelten Goertzel-Filterstruktur

Berechnungsart	komplexe Spannung	komplexer Strom	komplexe Impedanz in mΩ
FFT Matlab	-5.25154 - 2.93072i	-717.783 - 479.133i	6.94656 - 5.53939i
Goertzel Matlab	-5.25154 - 2.93072i	-717.783 - 479.133i	6.94656 - 5.53939i
Goertzel Filterstruktur	-5.25137 - 2.93106i	-717.774 - 479.186i	6.94646 - 5.53885i

Im Vergleich der obenstehenden Werte ist zu erkennen, dass es Abweichungen in den Ergebnissen gibt. Allerdings handelt es sich dabei um minimale Abweichungen. Dies wird bei der Berechnung der komplexen Impedanz deutlich. So beträgt die Differenz im Realteil der Impedanz lediglich 100 nΩ. Im Imaginärteil liegt die Differenz zwischen den von Matlab berechneten Werten und den der Goertzel Filterstruktur bei 540 nΩ.

Da sich die Abweichungen zwischen den von Matlab berechneten Werten und der von der Filterstruktur berechneten Werten auf ein Minimum reduzieren, ist die Filterstruktur durchaus geeignet für den Einsatz auf dem Mikrocontroller.

Im Anhang H befindet sich ein nach dieser Filterstruktur entwickeltes PC-Testprogramm, mit dem sich die Goertzel-Filterstruktur mit verschiedenen Werten testen lässt.

## 6. Inbetriebnahme und Erprobung der Impedanzspektroskopie

In diesem Kapitel sollen die Inbetriebnahme und Erprobung der Impedanzspektroskopie durchgeführt werden. Dabei wird neben dem entwickelten Zellsensor auch das neu entwickelte Batteriesteuergerät getestet. Insbesondere soll dabei auf die Funktionen eingegangen werden, die für die funksynchronisierte Impedanzspektroskopie wichtig sind.

Die Erprobung der Impedanzspektroskopie soll mit Hilfe einer Testimpedanz durchgeführt werden. Verläuft diese erfolgreich, kann die Impedanzspektroskopie an Batteriezellen erfolgen. Dabei sollen Messreihen bei unterschiedlichen Alterungszuständen, unterschiedlichen Ladezuständen und verschiedenen Temperaturen durchgeführt werden.

Abbildung 6.1 zeigt einen der neuen Zellsensoren und das entwickelte Batteriesteuergerät mit aufgesteckter Stabantenne auf dem Transceiver-Erweiterungsmodul.



Abbildung 6.1.: Neu entwickeltes Messsystem mit Batteriesteuergerät und Zellsensor



## 6.1. Inbetriebnahme der entwickelten Hardware

Die Inbetriebnahme umfasst zunächst die Überprüfung der entwickelten Hard- und Software. Dabei sollen eventuell auftretende Fehler im Design oder der Programmierung gefunden und wenn möglich ausgebessert werden. Es werden sowohl die Hard- und Software des Batteriesteuergeräts, als auch der neu entwickelte Zellsensor getestet. Ein vollständiger Funktionstest des Batteriesteuergeräts ist allerdings nicht nötig, da dieses bereits in der Entwicklungsphase in der Arbeit [48] eingesetzt und erfolgreich getestet wurde. Dabei war allerdings noch keine Strommessung am Steuergerät implementiert.

Daher umfasst die Inbetriebnahme des Batteriesteuergeräts die folgenden Punkte:

- Kommunikation über das CC1101 Transceiver-Erweiterungsmodul
- Stromerfassung über das Strommess-Erweiterungsmodul

Die Inbetriebnahme des Zellsensors muss ausführlicher durchgeführt werden. Diese besteht aus den folgenden Punkten:

- Programmierung des Mikrocontrollers
- Berechnung des Anpassungsnetzwerks der Schleifenantenne
- Kontrolle der Spannungsversorgung
- Funktionstest der drahtlosen Kommunikation
- Abrufen einzelner Spannungswerte
- Steuerung der analogen Vorverarbeitung
- Funktionstest der dynamischen Laufzeitmessung
- Phasenrichtige Aufnahme der Spannung und abrufen der Daten

### 6.1.1. Inbetriebnahme des Batteriesteuergeräts

Abbildung 6.2 zeigt das aufgebaute Batteriesteuergerät mit den beiden aufgesteckten Erweiterungsmodulen. Ebenso sind die Stromkabel im linken Teil des Bildes zu sehen, die an das Strommess-Modul montiert sind.

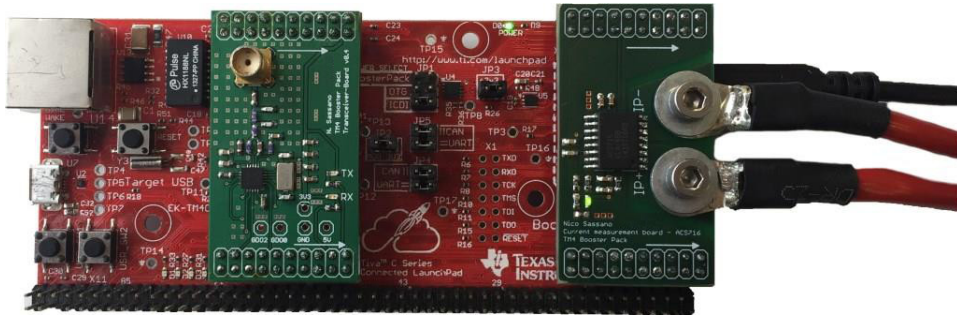


Abbildung 6.2.: Batteriesterngerät mit aufgesteckten Erweiterungsmodulen

### Kommunikation über das CC1101 Transceiver-Erweiterungsmodul

Einen ersten Funktionstest während der Entwicklungsphase hatten das Batteriesteuergerät und das CC1101-Erweiterungsmodul bereits in der Arbeit [48]. Deshalb wird an dieser Stelle auf einen Funktionstest verzichtet. Einen allgemeinen Funktionstest erhält das Steuergerät ebenfalls durch die Inbetriebnahme des Zellsensors, da die meisten Hard- und Softwarefunktionen durch das Steuergerät sowie das CC1101 Transceiver-Erweiterungsmodul ausgelöst werden. Abbildung 6.3 zeigt das bestückte CC1101 Transceiver-Erweiterungsmodul und die darauf verbauten Komponenten.

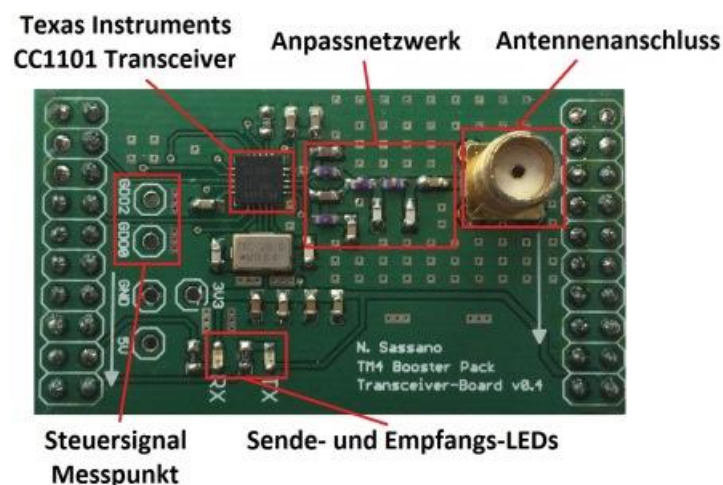


Abbildung 6.3.: Bestücktes CC1101 Transceiver-Erweiterungsmodul

### Stromerfassung über das Strommess-Erweiterungsmodul

Abbildung 6.4 zeigt das bestückte Strommess-Erweiterungsmodul. Neben dem eigentlichen Strommess-Hall-Sensor (ACS716), sind die Stromanschlüsse im unteren Teil der Platine farblich hervorgehoben.



Abbildung 6.4.: Bestücktes Strommess-Erweiterungsmodul

Um die Funktionsweise der Stromerfassung über das Strommess-Erweiterungsmodul zu überprüfen, soll ein Strom (50 Hz und 2,0 A Amplitude) erfasst und die aus dem Modul erzeugte Spannung gemessen werden. Die aus dem Modul ausgegebene Spannung hängt vom durchflossenen Strom ab. Die Spannung bei einem Strom von 0 A liegt dabei bei 1,65 V. Je nachdem, wie die Richtung des Stroms erfasst wird, steigt bzw. sinkt die Spannung um 100 mV/A<sup>1</sup>. Es wird nun durch einen Signalgenerator ein 50 Hz Wechselsignal generiert, welches gemessen werden soll.

Um den nötigen Strom von 2,0 A zu erzeugen, wird ein Kepco Leistungsverstärker eingesetzt der den Strom über einen Leistungswiderstand treibt. Das Strommess-Erweiterungsmodul erfasst dabei den fließenden Strom und erzeugt dazu eine Spannung, die gemessen werden soll. Den prinzipiellen Messaufbau zeigt Abbildung 6.5.

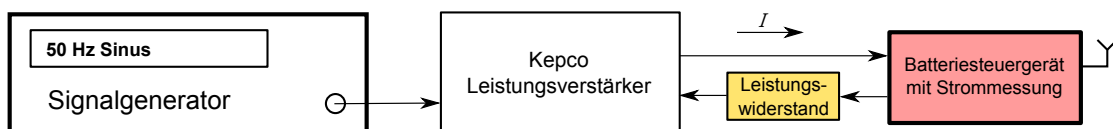


Abbildung 6.5.: Prinzipieller Messaufbau zum Test des Strommess-Erweiterungsmoduls

<sup>1</sup>ACS716 mit 6A max.: 100 mV/A, ACS716 mit 12A max.: 37 mV/A, ACS716 mit 25A max.: 18,5 mV/A

In Abbildung 6.6 ist die erzeugte Spannung am Strommess-Modul zu sehen. Zu erkennen ist, das durch den Signalgenerator erzeugte 50 Hz Sinussignal. Es lässt sich aus dieser Spannung der fließende Strom errechnen.

Dazu wird die Differenz der maximalen Spannung von ca. 2,26 V und der minimalen Spannung von 2,06 V bestimmt. Diese ergibt sich zu ca. 200 mV. Da es sich bei dem eingesetzten Strommess-IC um die Variante mit 6 A Maximalstrom handelt, kann der Strom zu 2 A bestimmt werden.

$$\Delta I = (\Delta \text{ Spannung in V}) / 100 \text{ mV/A} = ((2,26 \text{ V} - 2,06 \text{ V}) / 100 \text{ mV/A} = 2,0 \text{ A} \quad (6.1)$$

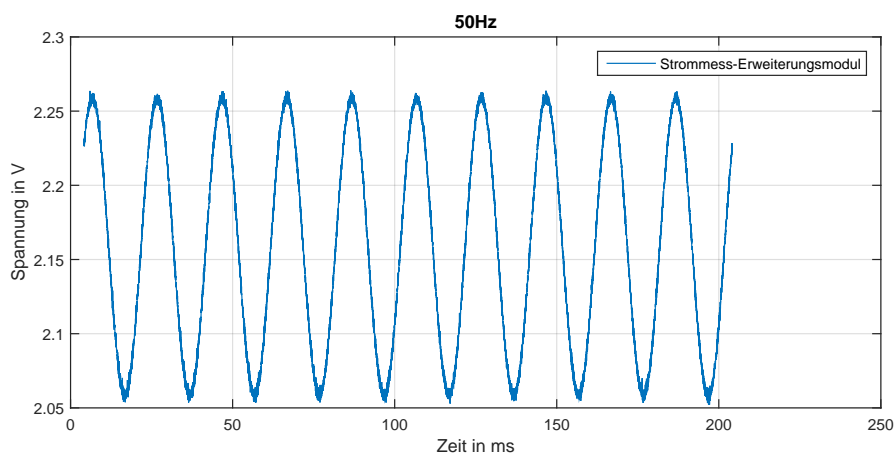


Abbildung 6.6.: Erzeugte Spannung durch das Strommess-Erweiterungsmodul

Dieser Test zeigt, dass das Strommess-Erweiterungsmodul wie erwartet funktioniert und somit für die Strommessung am Batteriesteuergerät eingesetzt werden kann.

### 6.1.2. Inbetriebnahme des Zellsensors

Die Abbildung 6.7 zeigt die Vorder- und Rückseite des bestückten Zellsensors. Einzelne Funktionsgruppen sowie einige aktive Bauelemente sind farblich hervorgehoben. Mittig ist der neu überarbeitete Anschluss zur elektrischen Verbindung zwischen dem Zellsensor und der Batteriezelle zu sehen. Dieser ist nun wesentlich kleiner dimensioniert als beim vorherigen Zellsensor.

Auf der Rückseite des Zellsensors befinden sich zwei JTAG-Interfaces. Es besteht die Möglichkeit der JTAG-Programmierung über eine Steckverbindung oder über einen Nadeladapter.

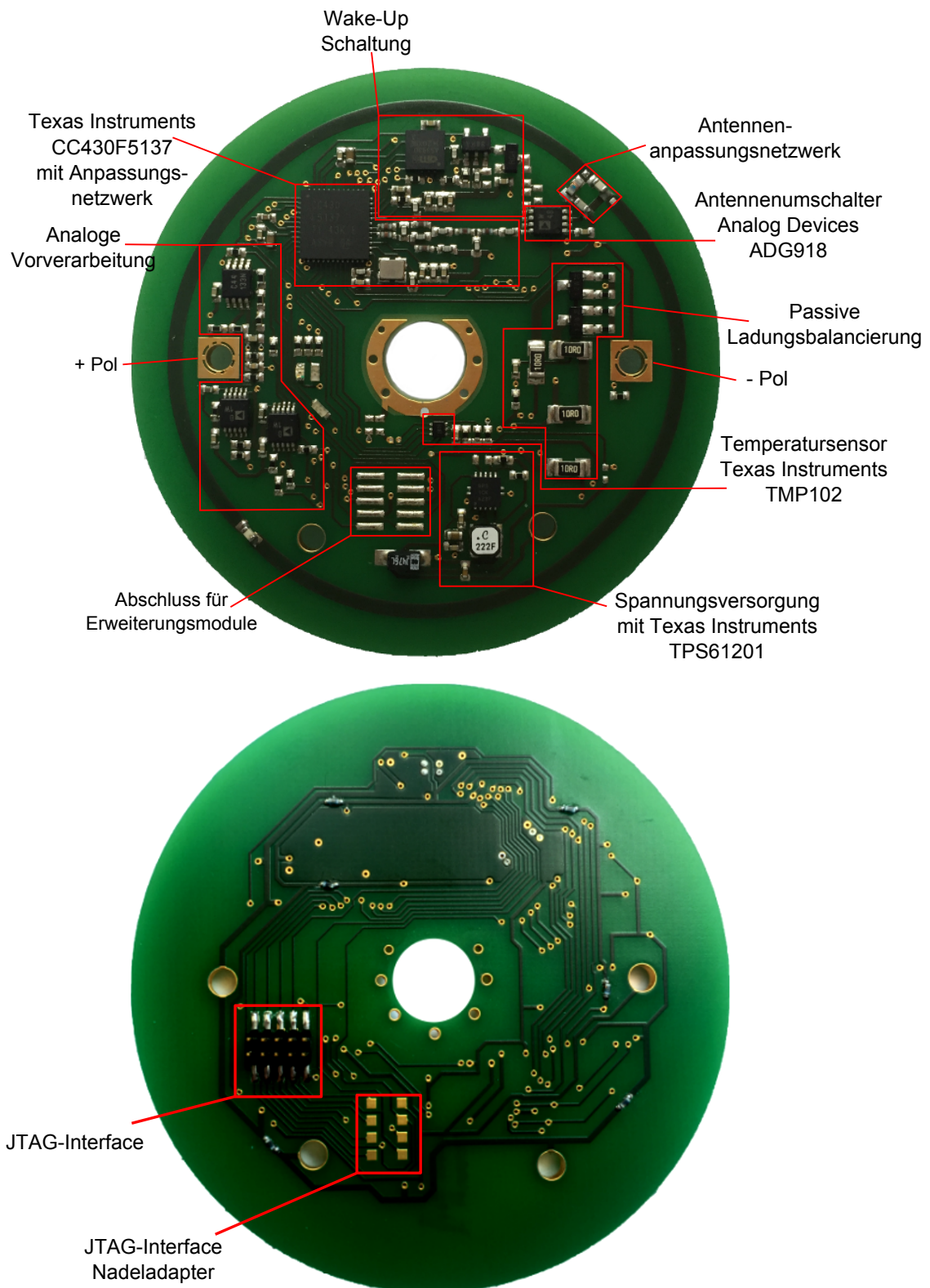


Abbildung 6.7.: Oben: Vorderseite des bestückten Zellsensors mit Beschriftung einzelner Funktionsteile und Bauteile.

Unten: Rückseite des Zellsensors mit den beiden JTAG-Interfaces

### Impedanzanpassung der Schleifenantenne

Durch die, während der Entwicklung des Zellsensors durchgeführten Simulationen (siehe Anhang C), waren bereits  $S_{11}$  Streuparameter für die Schleifenantenne bekannt. Anhand dieser Streuparameter konnte ein Anpassungsnetzwerk berechnet werden. Ob dieses berechnete Netzwerk jedoch am bestückten Sensor die simulierten Ergebnisse liefert, ist noch zu testen. Abbildung 6.8 zeigt das, aus den simulierten Streuparametern berechnete, Anpassungsnetzwerk und deren Bauteilwerte.

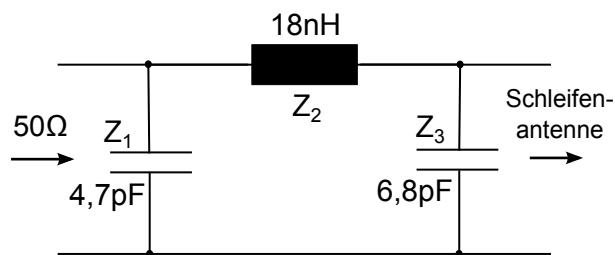


Abbildung 6.8.: Anpassungsnetzwerk der Schleifenantenne

Durch das, aus den Werten der Simulation berechnete Anpassungsnetzwerk, konnte die Resonanz der Schleifenantenne auf die gewünschten  $434\text{MHz}$  gebracht werden. Dabei nimmt der Eingangsreflexionsfaktor einen Wert von  $-17,92\text{dB}$  an, was einer Leistungsreflexion von lediglich ca.  $1,61\%$  entspricht.

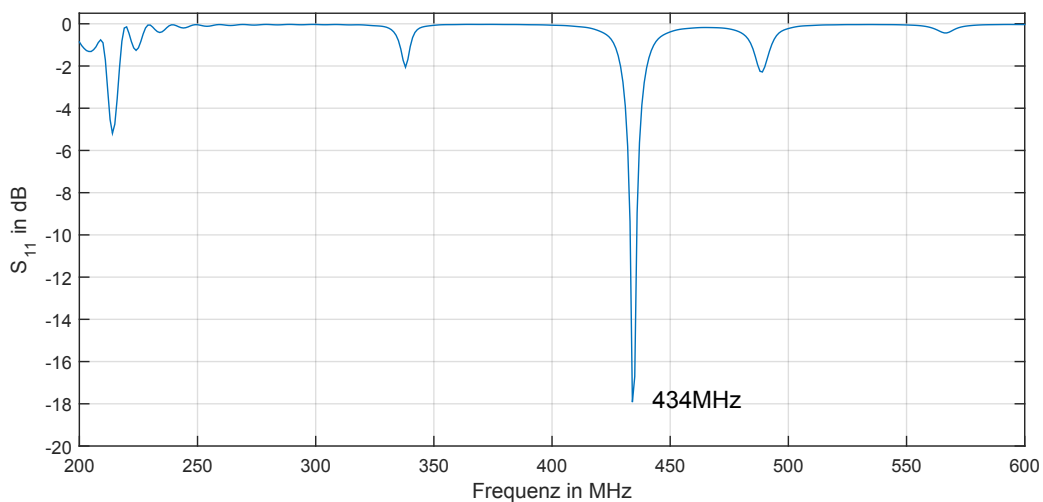


Abbildung 6.9.: Simulierte  $S_{11}$ -Parameter nach Anpassung der Schleifenantenne



Um die Abstrahleigenschaften mit dem berechneten Anpassungsnetzwerk zu testen, wurde ein Zellsensor im Abstand von 30 cm zu einem Spektrumanalysator aufgestellt. Dabei wurde die horizontale Abstrahlung des Zellsensors gemessen. Der Zellsensor strahlte dabei ein kontinuierliches Trägersignal mit einer Sendeleistung von 10 dBm ab. Abbildung 6.10 zeigt die durch den Spektrumanalysator empfangene Leistung. Zu sehen ist, dass sich der gesendete Träger deutlich vom Rauschen hervorhebt. Der Empfangspegel am Spektrumanalysator lag bei -38,66 dBm.

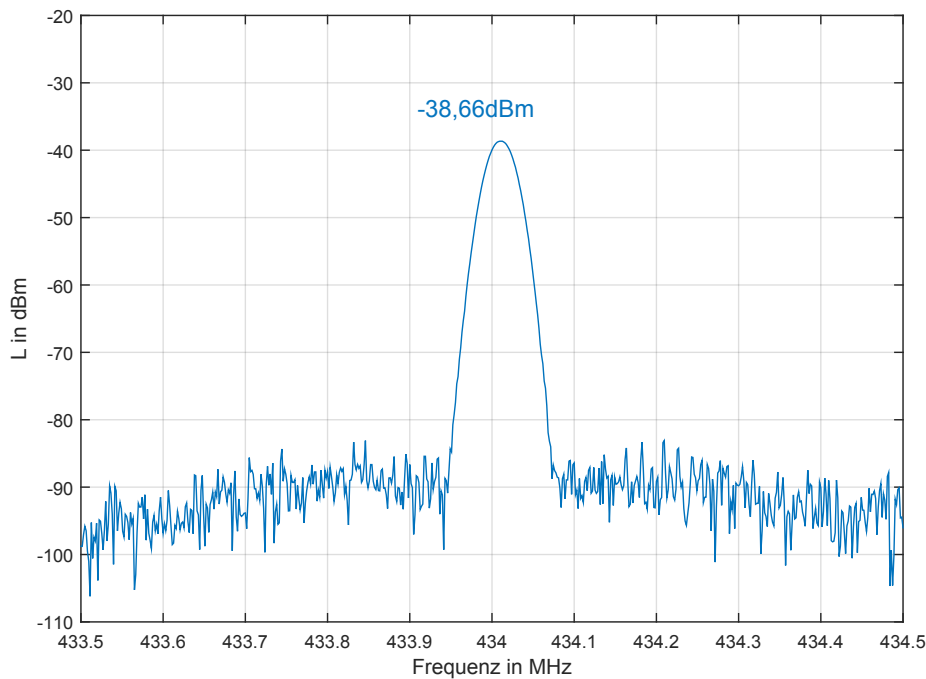


Abbildung 6.10.: Gemessene Abstrahlleistung der Schleifenantenne

Eine Datenkommunikation zwischen dem Zellsensor und dem Batteriesteuergerät ist damit ohne weiteres möglich. Erste Tests ergaben, dass damit eine paketorientierte Kommunikation zwischen Zellsensor und Steuergerät über eine Reichweite von >15 m möglich ist. Dies ist für die Erprobung sowie die Anwendung des Messsystems mehr als ausreichend. Daher wurde auf eine Vermessung der  $S_{11}$  Streuparameter mittels eines Netzwerk-Analysators an dieser Stelle verzichtet.

### Spannungsversorgung

Ein bekanntes Problem der entwickelten Zellsensoren war der Einfluss des eingesetzten DC/DC-Wandlers TPS61201 auf die zu messende Zellspannung. Durch interne Schaltvorgänge wurden Störungen auf die Zellspannung übertragen. Diese Störungen hatten eine Amplitudenhöhe von ca. 20 bis 25 mV, abhängig von der Belastung durch die Elektronik des Zellsensors. Da sich die zu messenden Amplituden der Batteriespannung aber im Bereich von wenigen mV befinden, überlagerten die Störungen des DC/DC-Wandlers die zu messende Batteriespannung. Eine Lösung dieses Problems wurde in [62] entwickelt. Durch ein kurzzeitiges Abschalten des DC/DC-Wandlers, kurz vor der Messung, konnten die Störungen zum Messzeitpunkt verhindert werden.

Durch diese kurzzeitige Abschaltung der Spannungsversorgung kommt es aber auch zu einem kurzen Spannungseinbruch der 3,3 V Versorgungsspannung auf dem Zellsensor. Die Spannung kann dabei bis auf einen Wert von 2,7 V einbrechen. Es zeigte sich in der Arbeit [62], dass ein solcher Einbruch für die digitalen Bauelemente auf dem Zellsensor kein Problem darstellen.

Da nun aber auch eine analoge Baugruppe eingesetzt wird, ist der Einfluss dieser Abschaltung nochmals genauer zu untersuchen. Besonders anfällig für diesen Spannungseinbruch ist die Subtrahierschaltung der analogen Vorverarbeitung, da hier die abzuziehende Spannung durch einen Spannungsteiler eingestellt wird, der über die 3,3 V Versorgungsspannung versorgt wird. Schwankt nun diese 3,3 V Versorgungsspannung, schwankt auch die abzuziehende Spannung an der Subtrahierschaltung. Die nachfolgenden Berechnungen zeigen, dass sich die Spannungsschwankung der abzuziehenden Spannung bei einem maximalen Spannungsabzug im Bereich von 3,267 V und 2,673 V bewegt.

$$U_{3,3\text{V}} = \frac{R_2 + R_{\text{Rheo,max.}}}{R_1 + R_2 + R_{\text{Rheo,max.}}} \cdot U_{\text{ref.}} = \frac{1\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega} \cdot 3,3\text{ V} = 3,267\text{ V} \quad (6.2)$$

$$U_{2,7\text{V}} = \frac{R_2 + R_{\text{Rheo,max.}}}{R_1 + R_2 + R_{\text{Rheo,max.}}} \cdot U_{\text{ref.}} = \frac{1\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega} \cdot 2,7\text{ V} = 2,673\text{ V} \quad (6.3)$$

Daraus ergibt sich der Schwankungsbereich  $\Delta_{\text{Schwankung}}$  der Subtrahierschaltung.

$$\Delta_{\text{Schwankung}} = U_{3,3\text{V}} - U_{2,7\text{V}} = 3,267\text{ V} - 2,673\text{ V} = 0,594\text{ V} \quad (6.4)$$

Diese Schwankungen machen sich in der Ausgangsspannung der Subtrahierschaltung bemerkbar. Der Gleichspannungsbereich der Messspannung ist nun nicht mehr auf einer konstanten Spannung, sondern bewegt sich innerhalb des Schwankungsbereichs  $\Delta_{\text{Schwankung}}$ . Ist die Subtrahierschaltung nicht auf den maximalen Spannungsabzug eingestellt, ist die Auswirkung auf die Ausgangsspannung auch geringer. Bei einem minimalen Spannungsabzug liegt der Schwankungsbereich der Spannung aber immer noch bei ca. 200 mV.



Eine Messung der 3,3 V Versorgungsspannung und der Spannung am AD-Wandler Eingang bei einer Verstärkung  $V = 0$  bestätigen diese Berechnung. Abbildung 6.11 zeigt den Einfluss durch die Spannungseinbrüche der 3,3 V Spannungsversorgung auf die analoge Vorverarbeitung.

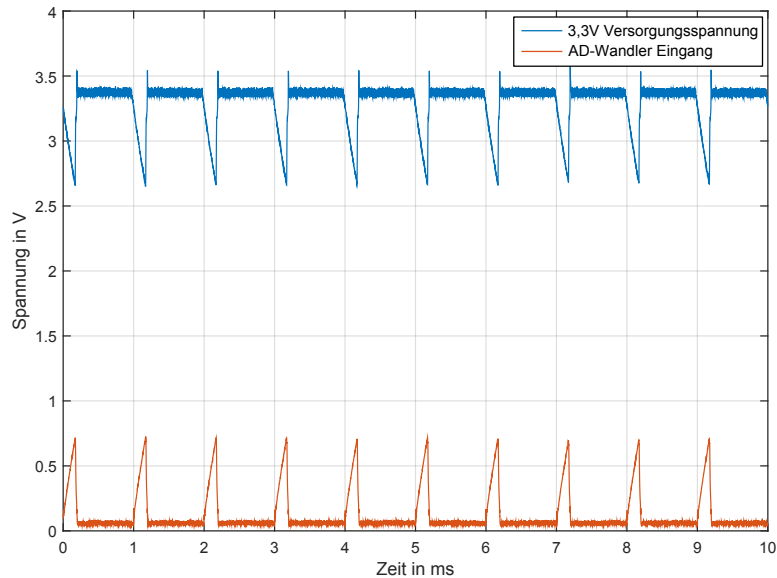


Abbildung 6.11.: Einfluss der Abschaltung des TPS61201 auf die analoge Vorverarbeitung

In der Abbildung 6.11 ist zu erkennen, dass sich die Einbrüche in der Spannungsversorgung nahezu gleich auf die Messspannung niederschlagen. Wird die Messspannung nun noch verstärkt, wird der Fehler noch vergrößert. Es kommt zu einem Fehler in der Messung bzw. die Messspannung geht über den Referenzspannungsbereich des AD-Wandlers hinaus.

Dieser Einfluss auf die Messspannung ist durchaus kritisch einzuschätzen. Aus der Konzeptionierung der analogen Vorverarbeitung in Kapitel 3.5.2 ist bekannt, dass der Gleichspannungsanteil der Messspannung so gering wie möglich sein sollte. Ein Schwanken des Gleichspannungsanteils im Bereich von mehreren 100 mV ist dabei nicht zulässig und verhindert die Möglichkeit, eine genaue Messung durchzuführen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, alle weiteren Messungen, die mit der analogen Vorverarbeitung durchgeführt werden, mit einer externen Spannungsversorgung durchzuführen. Dadurch wird die zu messende Zellspannung nicht durch Störungen des DC/DC-Wandlers beeinflusst und es finden keine Spannungseinbrüche der 3,3 V Spannungsversorgung durch Abschaltung des DC/DC-Wandlers statt.

Ein möglicher Lösungsansatz zur Stabilisierung der Spannungsversorgung wird im Anhang B behandelt, findet aber keinen Einsatz mehr in den weiteren Messungen und in dieser Arbeit.

### Steuerung der analogen Vorverarbeitung

In diesem Abschnitt soll die Steuerung der analogen Vorverarbeitung getestet werden. Implementiert wurde neben der automatischen Einstellung auch eine manuelle Einstellung der Vorverarbeitung. Manuelle Einstellungen lassen sich über das Batteriesteuergerät, mit den entsprechenden Einstellungswerten für die Rheostaten, übertragen. Einzelheiten zu den entsprechenden Befehlen finden sich im Anhang F.

Einen Funktionstest der automatischen Steuerung für die analogen des Vorverarbeitung zeigt die Messung in Abbildung 6.12. Dabei ist das Messsignal zu sehen, wie es durch die beiden Stufen der analogen Vorverarbeitung soweit bearbeitet wird, dass es durch den internen 12 Bit AD-Wandler des Mikrocontrollers gemessen werden kann. Diese beiden Stufen wurden bereits in Abschnitt 5.1.3 vorgestellt. Zu sehen ist zunächst die erste Stufe, in der der Gleichspannungsanteil abgezogen wird, bis die untere Grenzspannung erreicht wird. Ist diese erreicht, beginnt die 2. Stufe der analogen Vorverarbeitung. Dabei wird das Messsignal bis zum Erreichen der oberen Grenzspannung verstärkt.

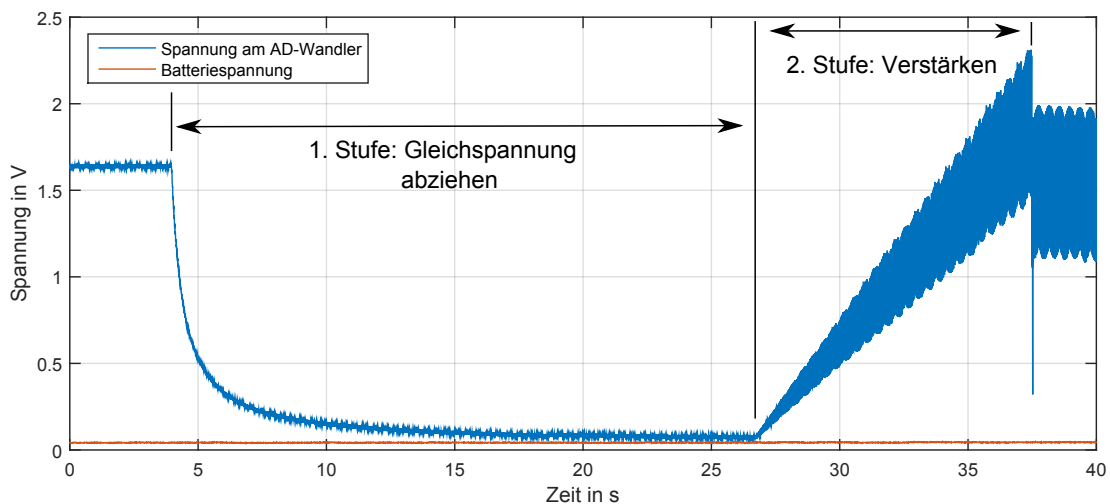


Abbildung 6.12.: Steuerung der analogen Vorverarbeitung

Der hintere Einbruch der verstärkten Messspannung, von ca. 2,30 V zu ca. 2,00 V, ist damit zu erklären, dass bei der Erreichung der oberen Grenzspannung, der interne DCO-Takt von 16 MHz auf 1 MHz umgeschaltet wird. Dadurch steigt die 3,3 V Versorgungsspannung leicht an, da die Strombelastung durch den Mikrocontroller hier ca. um den Faktor 10 sinkt [32]. Dies wirkt sich mit einem Absinken des Messsignals aus. Da die Burstmessung aber auch mit dem 16 MHz DCO-Takt durchgeführt wird, ist der erreichte Verstärkungsgrad richtig eingestellt. Bei dem in der Abbildung 6.12 zu sehenden Messsignal handelt es sich um ein 50 Hz Anregungssignal mit 1,2 A Wechselspannung. Dieses Signal konnte in

diesem Fall um den Faktor  $V = 46,12$  verstärkt werden. Durch eine Rechnung lässt sich erkennen, ob die Grenzwerte eingehalten wurden. Als obere Grenzspannung wurde  $2,30\text{ V}$  eingestellt. Dies lässt sich auch in der Abbildung 6.12 erkennen. Die untere Grenzspannung wurde auf  $30\text{ mV}$  gesetzt. Berechnen lässt sich dieser Grenzwert durch den Gleichanteil der Messspannung vor der DCO-Umschaltung mit ca  $1,45\text{ V}$ . Mit dem Wert der Verstärkung lässt sich die untere Grenzspannung wie folgt berechnen:

$$V_{\text{Untere Grenzspannung}} = \frac{\text{Gleichspannung nach Verstärkung}}{\text{Verstärkung}} = \frac{1,45\text{ V}}{46,12} = 31,52\text{ mV} \quad (6.5)$$

Es ist zu sehen, dass die automatische Steuerung der analogen Vorverarbeitung wie erwartet funktioniert und die gesetzten Grenzwerte eingehalten werden.

### Inbetriebnahme der dynamischen Laufzeitmessung

Die Inbetriebnahme der dynamischen Laufzeitmessung soll zeigen, ob das implementierte Verfahren genau genug ist, um eine verlässliche Aussage über das Laufzeitverhalten während der synchronisierten Messungen machen zu können. Dabei soll ein Vergleich zwischen den aufgenommenen Messdaten eines Oszilloskops und den mit der implementierten Laufzeitmessung aufgenommenen Messdaten durchgeführt werden.

Es wurde die Laufzeit von 1.500 Messungen aufgenommen und analysiert. Die dabei aufgenommenen Laufzeiten sind in Abbildung 6.13 zu sehen. Darin ist zu sehen, dass alle Messwerte ungefähr den gleichen zeitlichen Wert ergeben. Daran erkennt man, dass die implementierte Messung stabile Werte liefert. Dennoch sind Abweichungen an den Messwerten zu erkennen. Diese liegen, ausgehend vom Mittelwert bei  $15,86\ \mu\text{s}$ , im Bereich von  $\pm 0,85\ \mu\text{s}$ .

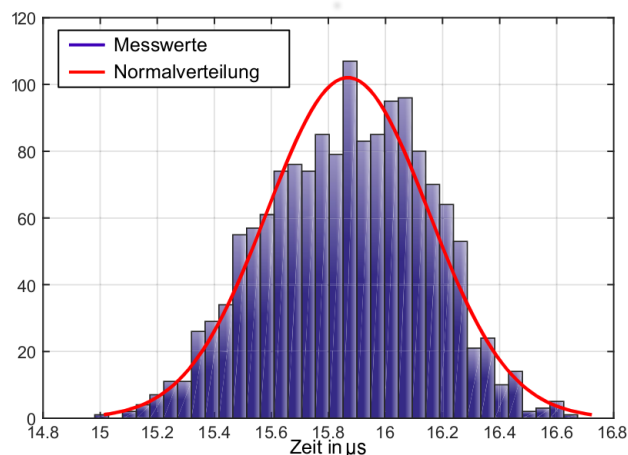


Abbildung 6.13.: Ermittelte Laufzeiten der dynamischen Laufzeitermittlung mit 1.500 Messwerten: Mittelwert =  $15,86\ \mu\text{s}$ ,  $\sigma = 0,2832\ \mu\text{s}$

Ob das implementierte Messverfahren auch qualitativ präzise Messwerte liefert, muss im Vergleich zu einer Messung der Laufzeit, die mit einem Oszilloskop gemessen wird, überprüft werden. Für eine solche Messung wird am Batteriesteuergerät der Zeitpunkt des Aussendens und der Ankunft am Zellsensor mit einem Oszilloskop gemessen. Die Signalisierung der Aussendung bzw. Ankunft des Impulses wird dabei an einem Messpin ausgegeben. Die Ergebnisse dieser Messung sind in Abbildung 6.14 zu sehen. Es zeigt sich, dass die Messung durch das Oszilloskop ähnliche Messwerte liefert wie die implementierte Laufzeitmessung.

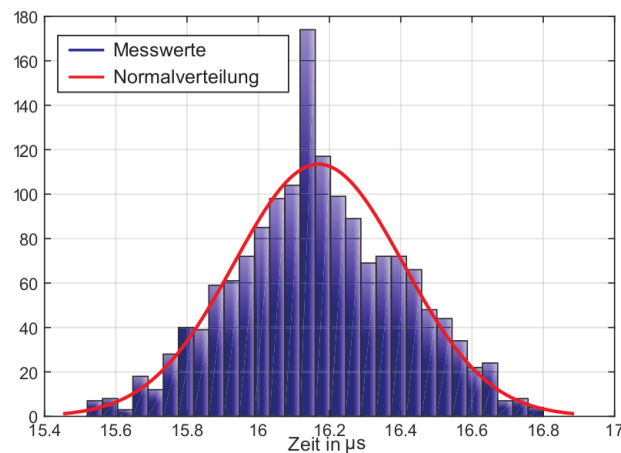


Abbildung 6.14.: Ermittelte Laufzeiten mittels Oszilloskop mit 1.500 Messwerten: Mittelwert =  $16,16 \mu s$ ,  $\sigma = 0,2274 \mu s$

Der Mittelwert der Oszilloskop-Messung liegt bei  $16,16 \mu s$ . Dies entspricht  $0,3 \mu s$  mehr, als bei dem Mittelwert des implementierten Messverfahrens. Dies zeigt, dass die Ergebnisse der dynamischen Laufzeitmessung durchaus auch eine qualitative Aussage der Laufzeit zwischen Batteriesteuergerät und Zellsensor liefern kann. In den beiden Abbildungen 6.13 und 6.14 lässt sich auch erkennen, dass die aufgenommenen Messwerte Gleichverteilt sind und sich durch eine Normalverteilung annähern lassen. Dadurch lässt sich die prozentuale Verteilung und Abweichung der Messwerte zum Mittelwert berechnen. So ergibt die Standardabweichung der Normalverteilungen aus der implementierten Laufzeitmessung, dass 68,3% [56] aller Messwerte eine maximale Abweichung von  $0,2832 \mu s$  haben.

In der Tabelle 6.1 sind nochmals alle wichtigen Ergebnisse zur Laufzeitmessung zusammengefasst.

Tabelle 6.1.: Vergleich der Ergebnisse der Laufzeitmessung

	Mittelwert	max. Abweichung	Standardabweichung $\sigma$
Implementierte Laufzeitmessung	$15,86 \mu s$	$\pm 0,85 \mu s$	$0,2832 \mu s$
Oszilloskop Laufzeitmessung	$16,16 \mu s$	$\pm 0,64 \mu s$	$0,2274 \mu s$

### Phasenrichtige Spannungsaufnahme des Messsystems

Bevor erste Messungen gestartet werden können, muss überprüft werden, ob eine phasenrichtige Aufnahme der Spannungswerte durch das Messsystem möglich ist. Dazu wird mittels eines Signalgenerators eine 10 Hz Wechselspannung mit 200 mV Amplitude an das Batteriesteuergerät sowie an einen Zellsensor gegeben. Abbildung 6.15 zeigt den dazugehörigen Messaufbau. Erwartet wird dabei, dass die Messwerte des Batteriesteuergerät sowie des Zellsensors phasenrichtig aufgenommen werden.

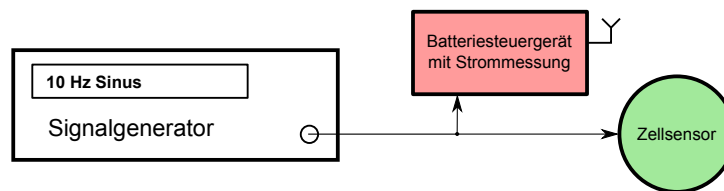


Abbildung 6.15.: Messaufbau für die phasenrichtige Strom- und Spannungsaufnahme des Messsystems

Die Beurteilung der phasenrichtigen Messung erfolgt dabei rein optisch. Wie in Abbildung 6.16 zu sehen ist, liegen die aufgenommenen Spannungen nahezu ideal übereinander. Eine Phasendifferenz zwischen den beiden Signalen ist nicht zu erkennen. Ebenso ist bei beiden Messungen die Amplitudenhöhe von 200 mV zu erkennen.

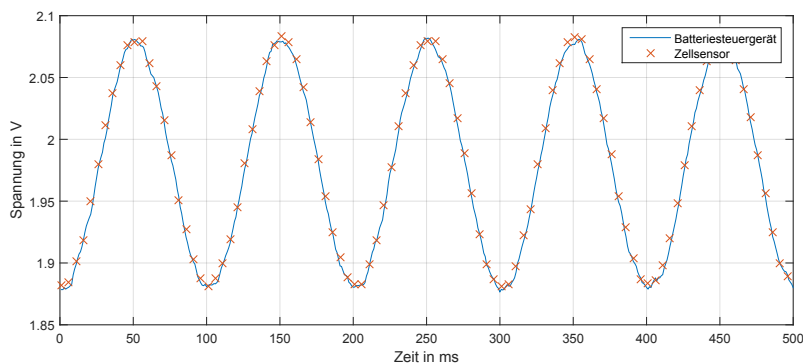


Abbildung 6.16.: Überprüfung der phasenrichtigen Spannungsaufnahme des Zellsensors und des Batteriesteuergeräts

Da nun alle für die Impedanzspektroskopie erforderlichen Hard- und Softwareteile getestet werden konnten, können ersten Impedanzmessungen durchgeführt werden.

## 6.2. Impedanzmessungen

In diesem Abschnitt sollen mit dem entwickelten Messsystem erste Impedanzmessungen durchführen werden. Insbesondere soll die Synchronität zwischen Strom- und Spannungsmessungen überprüft und angepasst werden. Dazu wird zunächst eine Testimpedanz vermessen. Verläuft diese Messung positiv, kann die Impedanzmessung an realen Batteriezellen getestet werden.

### 6.2.1. Vermessung einer Testimpedanz

Für die erste Messung wird eine Testimpedanz aufgebaut. Der Vorteil einer solchen Testimpedanz liegt darin, dass sich hier die Bauteilwerte nicht verändern. Bei einer Batteriezelle können sich von Messung zu Messung die Messwerte der Impedanz verändern. Diese Veränderungen werden unter anderem hervorgerufen durch die Alterung der Zelle, durch die Veränderung des Ladezustands sowie der Änderung der Zelltemperatur. Da bereits kleinste Änderungen dieser Werte das Impedanzspektrum beeinflussen, wird für die erste Inbetriebnahme eine Testimpedanz entworfen.

Anhand dieser Testimpedanz kann nun das Messverfahren erprobt und die Synchronität angepasst werden. Bei der Entwicklung dieser Testimpedanz wurde versucht, in den erwartenden Impedanzbereich von wenigen  $m\Omega$  zu gelangen. Ebenfalls soll der Frequenzbereich, der bei der Impedanzspektroskopie durchfahren wird, annähernd erreicht werden. Abbildung 6.17 zeigt die dabei entstandene Testimpedanz.

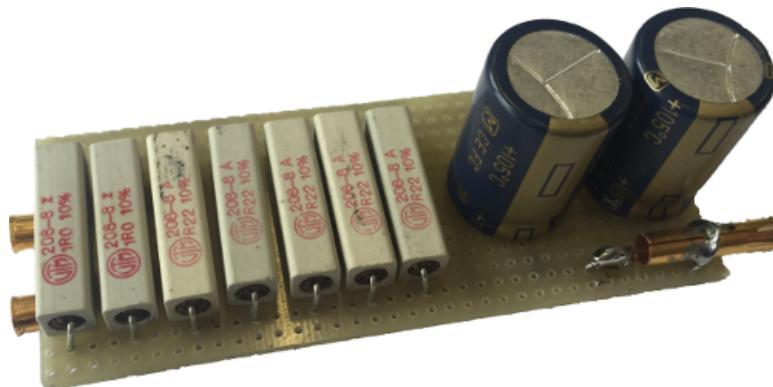


Abbildung 6.17.: Entwickelte Testimpedanz

Die Testimpedanz wird, wie das in Abschnitt 2.3.1 vorgestellte Batteriemodell, aufgebaut. Dieses Batteriemodell besteht aus einem Vorwiderstand und einem daran anschließenden RC-Glied. Das daraus entstehende Impedanzspektrum bildet in der Nyquist-Darstellung einen Halbkreis. Die Breite dieses Halbkreises wird bestimmt durch den ohmschen Anteil

im RC-Glied. Da dieser im  $m\Omega$  Bereich liegen soll, werden fünf mal  $220\text{ m}\Omega$  Widerstände parallel geschaltet. Dadurch erreicht der Impedanz-Halbkreis eine Breite von  $44\text{ m}\Omega$ . Der Frequenzbereich sollte mindestens von  $2\text{ kHz}$  bis in einen niedrigen Frequenzbereich von  $1\text{ Hz}$  reichen. Dabei soll der Halbkreis möglichst komplett abgefahren werden. Durch die erarbeitete Formel 2.29 aus Abschnitt 2.3.1 wird ersichtlich, dass dazu die eingesetzte Kapazität möglichst groß gewählt werden muss.

Eingesetzt werden nun zwei parallel geschaltete  $10.000\text{ }\mu\text{F}$  Kondensatoren. Dadurch wird erreicht, dass der Imaginärteil der Impedanz bei  $2\text{ kHz}$  weitestgehend den Nulldurchgang erreicht. Dadurch kann der komplette Halbkreis abgefahren werden.

Da sich die Impedanzmessung nun im Bereich von wenigen  $m\Omega$  bewegt, ist der Serienwiderstand (ESR<sup>2</sup>) der eingesetzten Kapazitäten zu beachten. Da diese auch Einfluss auf das erzeugte Impedanzspektrum haben. Abbildung 6.18 zeigt die entwickelte Schaltung der Testimpedanz.

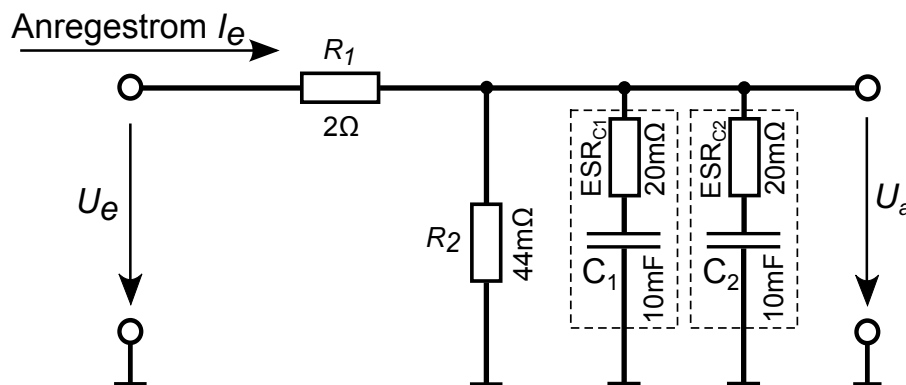


Abbildung 6.18.: Schaltplan der entwickelten Testimpedanz

Der Widerstand  $R_1$  dient in dieser Schaltung lediglich als Strombegrenzung, hat aber keinen Einfluss auf die gemessene Impedanz, da die Ausgangsspannung  $U_a$  lediglich über den Widerstand  $R_2$  und die beiden Kondensatoren  $C_1$  und  $C_2$  gemessen wird.

Angeregt wird die Testimpedanz bei dieser Messung mittels des FuelCon TrueData-EIS. Dies hat den Vorteil, dass der Anregestrom  $I_e$  genau eingestellt werden kann. Die Strommessung erfolgt über das Stommess-Erweiterungsmodul des Batteriesteuergeräts. Die Ausgangsspannung  $U_a$  der Testimpedanz wird von einem Zellsensor gemessen. Den prinzipiellen Messaufbau zur Vermessung der Testimpedanz zeigt Abbildung 6.19.

<sup>2</sup>Equivalent Series Resistance

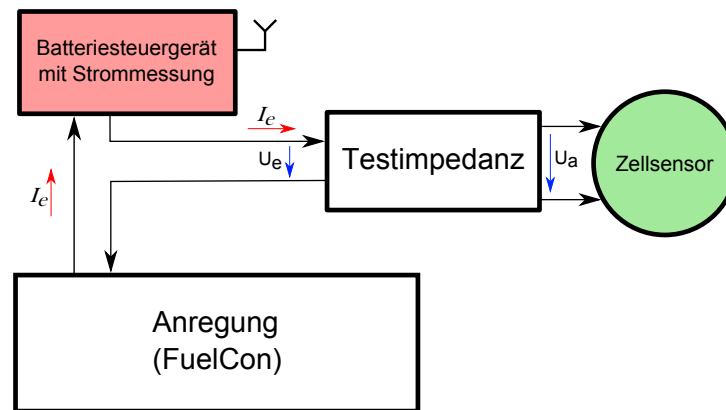


Abbildung 6.19.: Prinzipieller Messaufbau zur Vermessung der Testimpedanz

Die Messung erfolgt in 13 unterschiedlichen Frequenz-Messpunkten. Diese sind in Tabelle 6.2 mit den dazugehörigen Burstfrequenzen angegeben. Diese willkürlichen Frequenzwerte ergaben sich durch eine erste Testmessung mit dem FuelCon TrueData-EIS und wurden zum Vergleich der Messergebnisse übernommen.

Tabelle 6.2.: Frequenz-Messpunkte der Testimpedanz-Messung

Messpunkt	Frequenz	Burstfrequenz
1	1,0 Hz	500 Hz
2	5,24 Hz	500 Hz
3	9,10 Hz	1.000 Hz
4	20,84 Hz	1.000 Hz
5	36,20 Hz	1.000 Hz
6	62,87 Hz	1.000 Hz
7	82,87 Hz	1.000 Hz
8	143,95 Hz	2.000 Hz
9	250,04 Hz	8.000 Hz
10	434,32 Hz	8.000 Hz
11	754,42 Hz	8.000 Hz
12	1310,44 Hz	8.000 Hz
13	2276,25 Hz	8.000 Hz

Als Anregestrom wurde ein Wechselstrom von 1,2 A gewählt. Durch den niedrig gewählten Wechselanteil liegt die zu messende Wechselspannung auch in einem kleinen mV Bereich, wie sie bei einer Impedanzspektroskopie an einer realen Batteriezelle zu erwarten ist. Dadurch, dass es sich bei dieser Messung um keine aktive Batteriezelle mit überlagertem Gleichspannungsanteil handelt, ist der Gleichspannungsanteil der zu messenden Spannung



sehr gering. Aus diesem Grund kann das Messsignal durch die analoge Vorverarbeitung sehr gut verstärkt werden. Allerdings muss für die eine Messung, mit geringem Gleichanteil  $< 1,65\text{ V}$ , die Subtrahierschaltung geändert werden. Dazu sind lediglich die beiden Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  aus der Schaltung 4.9 auf Seite 99 zu entfernen. Dies bewirkt, dass wieder ein Gleichspannungsabzug von  $0,0\text{ V}$  möglich ist.

Abbildung 6.20 zeigt das Ergebnis der ersten Impedanzmessung der Testimpedanz. Zu sehen ist zum einen das theoretische Impedanzspektrum, dass sich aus der Simulation der Schaltung ergibt. Zum anderen sind die Ergebnisse der Messung mit dem FuelCon TrueData-EIS (EIS Meter) und der Messung mit dem Zellsensor zu sehen. Beispielhaft sind drei verschiedene Frequenzpunkte im Spektrum eingezeichnet, um eine Orientierung der Frequenzpunkte zu bekommen.

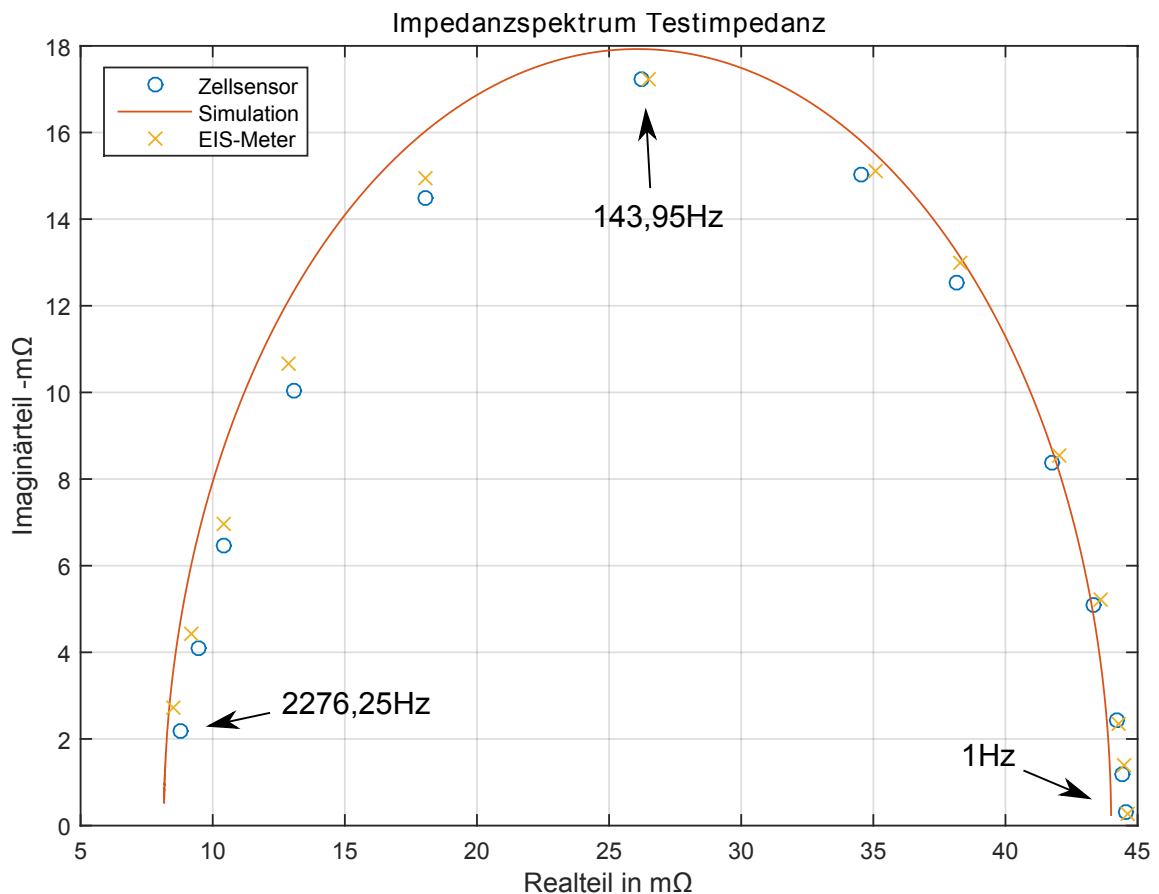


Abbildung 6.20.: Erste Impedanzmessung an der Testimpedanz mit einer Synchronisationszeit von  $72,2\mu\text{s}$

Zu erkennen ist, dass sich die beiden Messungen dem simulierten Spektrum annähern. Es gibt aber vor allem noch Unterschiede im Imaginärteil des Spektrums. Es wird nun ange-

nommen, dass die Messwerte des FuelCon TrueData-EIS die genaueren Messwerte liefert. Die Abweichung zwischen den simulierten Werten und denen des FuelCon TrueData-EIS werden in den Abweichungen der verwendeten Bauteile liegen. Vor allem die eingesetzten Kondensatoren können eine maximale Abweichung von bis zu  $\pm 20\%$  [55] aufweisen. Simulationen ergaben, dass diese Abweichung durch einen leicht erhöhten ESR der Kondensatoren zustande kommen kann.

Nun ist die Abweichung zwischen den Werten des FuelCon TrueData-EIS und den Messwerten des in dieser Arbeit entwickelten Messsystems zu untersuchen. Es ist zu erkennen, dass der Realteil der Messwerte bei beiden Messungen nahezu übereinstimmen. Lediglich die Imaginärteile liegen etwas auseinander. Bei niedrigen Frequenzen ist die Abweichung geringer als bei hohen Frequenzen. Dieses Verhalten deutet auf eine fehlerhafte Synchronisationszeit zwischen Strom- und Spannungsmessung hin und geht aus den Berechnungen in Abschnitt 3.3 hervor. Durch diese Rechnungen wurde deutlich, dass eine zu lange Verzögerung zwischen Strom- und Spannungsaufnahme sich vor allem in einem zu großen Imaginärteil auswirkt. Im Umkehrschluß bedeutet dies, dass eine zu kurze Synchronisationszeit zwischen Strom- und Spannungsaufnahme zu einem geringeren Imaginärteil führt.

Durch diese Messung an der Testimpedanz lässt sich also feststellen, dass eine Erfassung des Impedanzspektrums möglich ist, das Messsystem selber aber noch nicht ausreichend genug synchronisiert ist. Die Messungen an der Testimpedanz wurden mit der in Abschnitt 3.3 berechneten Verzögerungszeit zwischen Taktausendung und Stromaufnahme von  $72,2 \mu\text{s}$  aufgenommen. Die Synchronität des Messsystems muss also weiter untersucht und die Synchronisationszeit korrigiert werden.

### 6.2.2. Untersuchung der Synchronität des Messsystems

Die vorherige Messung an der Testimpedanz hat gezeigt, dass die Zeit zwischen der Aussendung des Messimpulses und der Aufnahme der Strom- und Spannungswerte zu gering ist. Es wird nun nach möglichen Ursachen gesucht, die eine synchrone Aufnahme verhindern.

Durch die implementierte Laufzeitmessung ist bekannt, dass die Laufzeit des Messimpulses zwischen Batteriesteuergerät und Zellsensor nicht wie in der Rechnung in Abschnitt 3.3  $18,4\mu\text{s}$  betragen, sondern lediglich  $15,86\mu\text{s}$ . Mit dieser verkürzten Laufzeit ergibt sich eine theoretische Synchronisationszeit von  $69,86\mu\text{s}$ . Die Zeit müsste sich also theoretisch verkürzen und nicht verlängern, wie es sich durch die Messung der Testimpedanz ergeben hat. Es muss also weitere Zeiten geben, die Einfluss auf die Synchronität des Messsystems haben.

Betrachtet wurde bisher nicht die Zeit, die der AD-Wandler des Batteriesteuergeräts benötigt, um die Spannung des Strommess-Erweiterungsmoduls aufzunehmen. Der AD-Wandler ist so eingestellt, dass dieser  $3,2\mu\text{s}$  für eine Spannungsaufnahme benötigt. Diese Zeit verkürzt die nötige Wartezeit für eine synchrone Strom- und Spannungsaufnahme auf  $66,66\mu\text{s}$ . Abbildung 6.21 gibt einen Überblick über die bisher ermittelten Zeiten, die für die Synchronität des Messsystems verantwortlich sind.

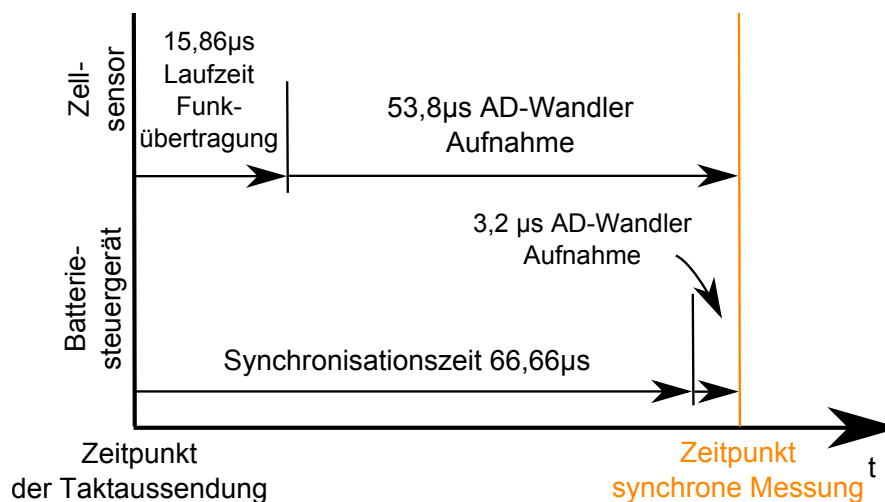


Abbildung 6.21.: Zeiten für die synchrone Strom- und Spannungsmessung

Bei einer Untersuchung der analogen Vorverarbeitung wurde festgestellt, dass diese einen Amplituden- und einen linearen Phasengang besitzt, und somit eine Verzögerung des Messsignals verursacht. Abbildung 6.22 zeigt den gemessenen Amplituden- und Phasengang der analogen Vorverarbeitung.

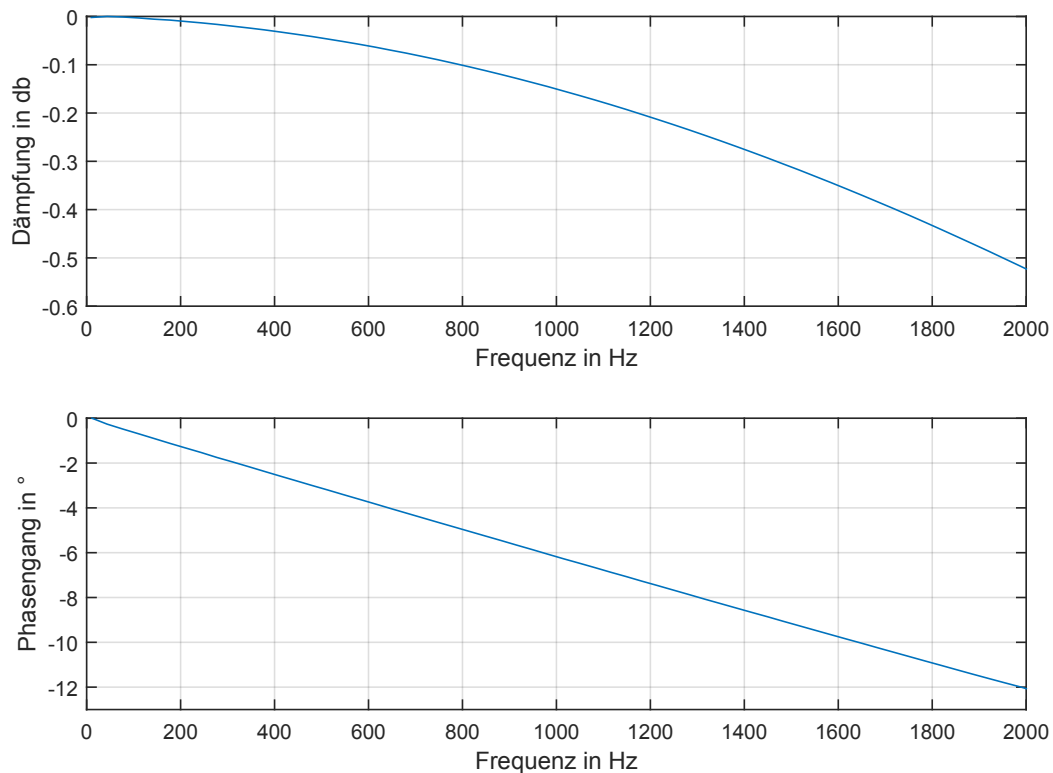


Abbildung 6.22.: Gemessener Amplituden- und Phasengang der analogen Vorverarbeitung

Durch den gemessenen Phasengang lässt sich eine zusätzlich benötigte Zeit, die für die Synchronisation notwendig ist, berechnen. Da es sich hierbei um einen linearen Phasengang handelt, kann ein beliebiger Punkt genommen werden, um die daraus resultierende Laufzeitverzögerung zu ermitteln. In diesem Fall wird der Punkt bei 2 kHz gewählt. Die durch den Phasengang verursachte Laufzeitverzögerung ergibt sich dadurch zu  $16,66 \mu\text{s}$ .

$$t_{\text{Phasengang}} = -\frac{\text{Periodenzeit [s]}}{360^\circ} \cdot \text{Phasengang [}^\circ\text{]} = -\frac{1}{2 \text{ kHz}} \cdot -12^\circ = 16,66 \mu\text{s} \quad (6.6)$$

Eine weitere Analyse des Messsystems ergab, dass neben der analogen Vorverstärkung auch das Strommess-Erweiterungsmodul eine Verzögerung zwischen den durchfließenden Strom und der daraus resultierenden Spannung aufzeigt. Der Hersteller des Strommess-IC ACS716 gibt für diesen Baustein eine typische Reaktionszeit von  $4 \mu\text{s}$  [49] an, die in die Synchronisationszeit mit einbezogen werden muss.

Aus dieser Analyse des Messsystems geht hervor, dass eine unterschiedliche Phasenverschiebung zwischen Strom- und Spannung herrscht. Um dennoch synchrone Messwerte zu erhalten, muss die Zeitdifferenz zwischen Strom- und Spannung ermittelt und auf die Synchronisationszeit beaufschlagt werden. Diese Zeitdifferenz zwischen Messspannung

und Strom berechnet sich zu  $12,66\mu\text{s}$ .

$$\Delta t = 16,66\mu\text{s} - 4,0\mu\text{s} = 12,66\mu\text{s} \quad (6.7)$$

Die Verschiebung zwischen Strom- und Spannung veranschaulicht Abbildung 6.23.

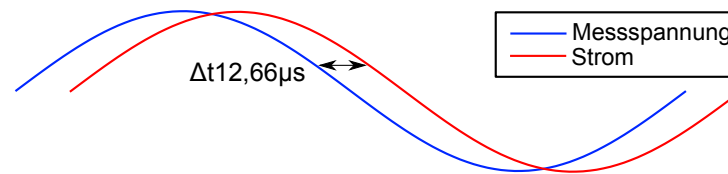


Abbildung 6.23.: Veranschaulichung der zeitlichen Verschiebung zwischen Messspannung und Strom

Es konnten durch die Analyse des Messsystems weitere Zeiten ermittelt werden, die bei der Berechnung der Synchronisationszeit miteinbezogen werden müssen. So benötigt der Zellsensor, nach dem Aussenden des Taktsignals insgesamt  $69,86\mu\text{s}$  bis die Spannungsaufnahme stattfindet. Das Batteriesteuergerät benötigt für die Messwerterfassung des Stromes insgesamt  $3,2\mu\text{s}$ . Die Verschiebung zwischen Strom- und Spannung beträgt  $12,66\mu\text{s}$ . Aus diesen Zeiten ergibt sich eine neue Synchronisationszeit von  $79,12\mu\text{s}$ .

$$\text{Synchronisationszeit} = (69,86\mu\text{s} + 12,66\mu\text{s}) - 3,2\mu\text{s} = 79,12\mu\text{s} \quad (6.8)$$

Für eine synchrone Messung ist der Strom erst  $12,66\mu\text{s}$  nach der Spannung zu messen. In Abbildung 6.24 werden die einzelnen Zeiten nochmals aufgeführt und entsprechend eingeordnet.

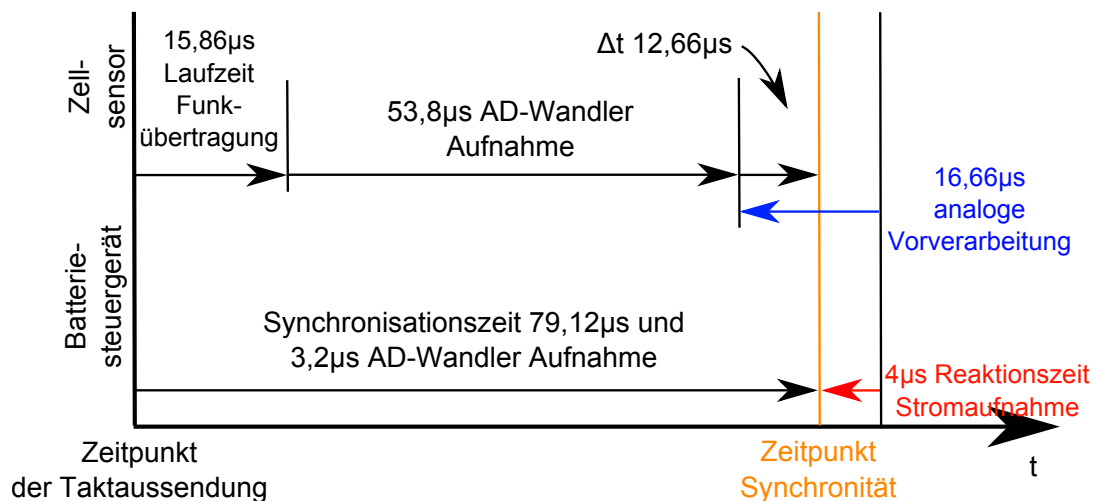


Abbildung 6.24.: Zusammensetzung der Zeiten für eine synchrone Strom- und Spannungsmessung

Mit dieser ermittelten Synchronisationszeit, kann nun eine erneute Messung an der Testimpedanz durchgeführt werden. Auch der in der Abbildung 6.22 zu sehende Amplitudengang kann nun bei der neuen Messung in die Berechnung der Impedanzen miteinbezogen werden.

Die erneute Messung der Testimpedanz mit angepasster Synchronisationszeit zeigt Abbildung 6.25.

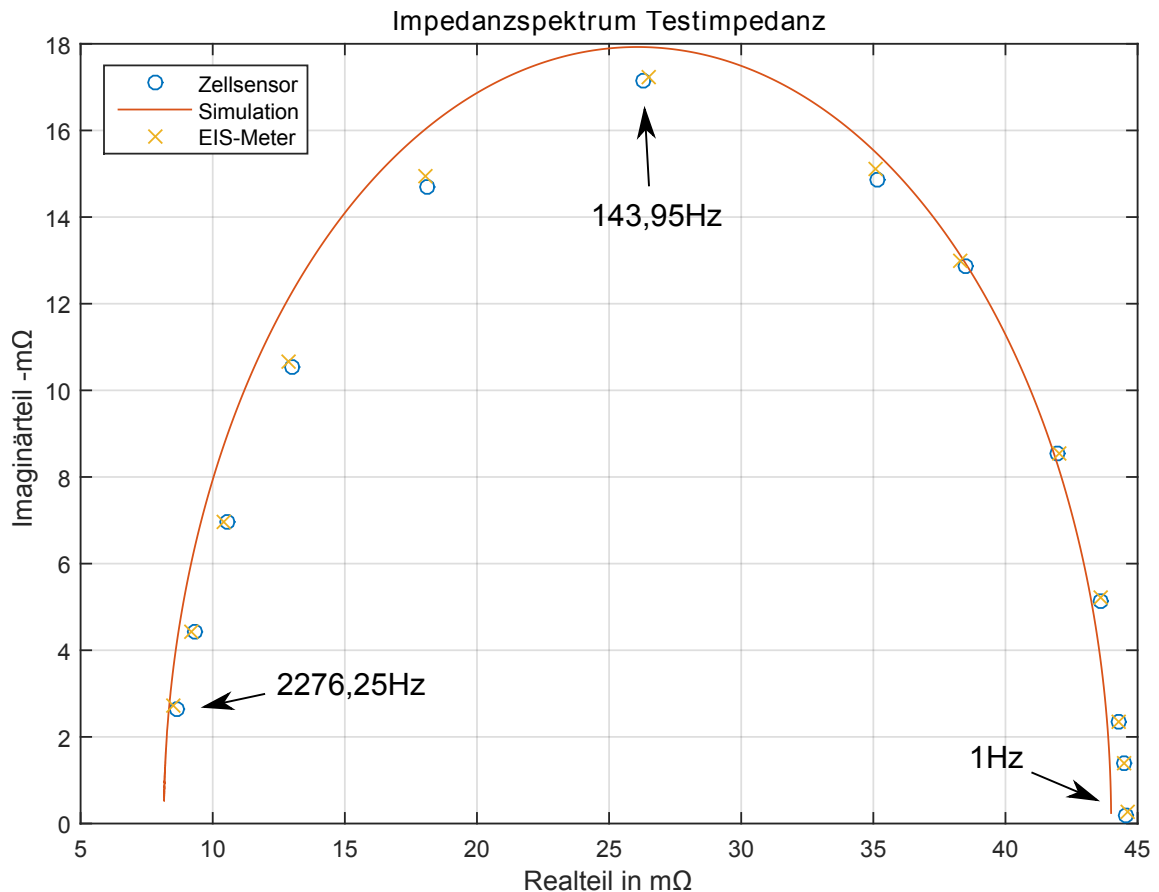


Abbildung 6.25.: Synchrones Impedanzspektrum der Testimpedanz mit einer Synchronisationszeit von  $79,12\mu s$

Es zeigt sich, dass die Impedanzmessung mit einer Wartezeit zwischen Taktausendung und Strommessung von  $79,12\mu s$  nun mit den Messwerten des FuelCon TrueData-EIS nahezu übereinstimmen. Der Imaginärteil der Messwerte ist nach der Erhöhung der Synchronisationszeit wie erwartet angestiegen.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass das Messsystem nun synchrone Messungen zwischen Strom- und Spannungswerten liefert. Da die Messungen an der Testimpedanz erfolgreich sind, können nun erste Messungen an realen Batteriezellen durchgeführt werden.

### 6.3. Erprobung der Impedanzspektroskopie

Zur Erprobung der Impedanzspektroskopie an realen Batteriezellen wird wie bei der Messung der Testimpedanz zwischen den gemessenen Werten des FuelCon TrueData-EIS und den Messwerten des in dieser Arbeit realisierten Messsystems verglichen. Allerdings ist besonders im niedrigen Frequenzbereich mit Abweichungen zu rechnen, da dieser Bereich stark ladungsabhängig ist und von Messung zu Messung schwanken kann.

Vermessen werden LiFePO<sub>4</sub>-Zellen von A123 (Typ: ANR26650M1-B). Diese besitzen einen typischen Innenwiderstand bei 1 kHz von 6mΩ [1]. Vermessen werden dabei die in der Tabelle 6.3 aufgeführten zwölf Messpunkte mit der jeweilig angegebenen Burstfrequenz. Angeregt wird die Batteriezelle dabei über das FuelCon TrueData-EIS mit einem Wechselstromanteil von 1,2 A.

Tabelle 6.3.: Frequenzpunkte der gemessenen Impedanzspektroskopie

Messpunkt	Signalfrequenz	Burstfrequenz
1	0,1 Hz	50,0 Hz
2	0,5 Hz	100,0 Hz
3	1,0 Hz	200,0 Hz
4	5,0 Hz	200,0 Hz
5	10,0 Hz	500,0 Hz
6	50,0 Hz	2.000,0 Hz
7	100,0 Hz	2.000,0 Hz
8	250,0 Hz	8.000,0 Hz
9	500,0 Hz	8.000,0 Hz
10	750,0 Hz	8.000,0 Hz
11	1.000,0 Hz	8.000,0 Hz
12	2.000,0 Hz	8.000,0 Hz

Die Abbildung 6.26 zeigt den bei den folgenden Messungen verwendeten Messaufbau für die Impedanzspektroskopie.

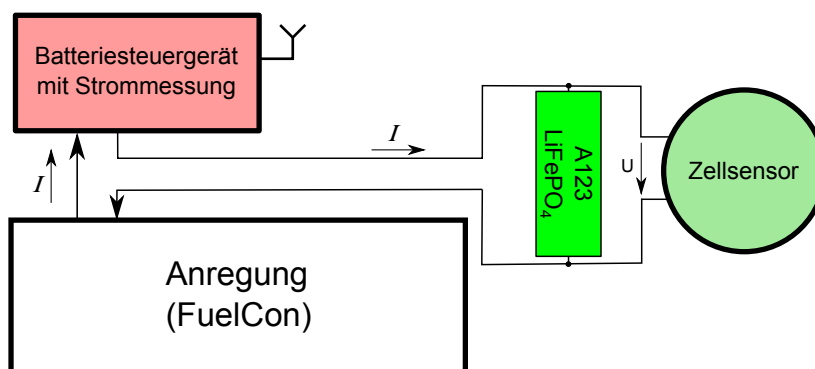


Abbildung 6.26.: Messaufbau für die Impedanzspektroskopie an einer LiFePO<sub>4</sub>-Zelle

### 6.3.1. Impedanzmessung einer Batteriezelle

Das Ergebnis der Impedanzmessung einer realen Batteriezelle zeigt Abbildung 6.27.

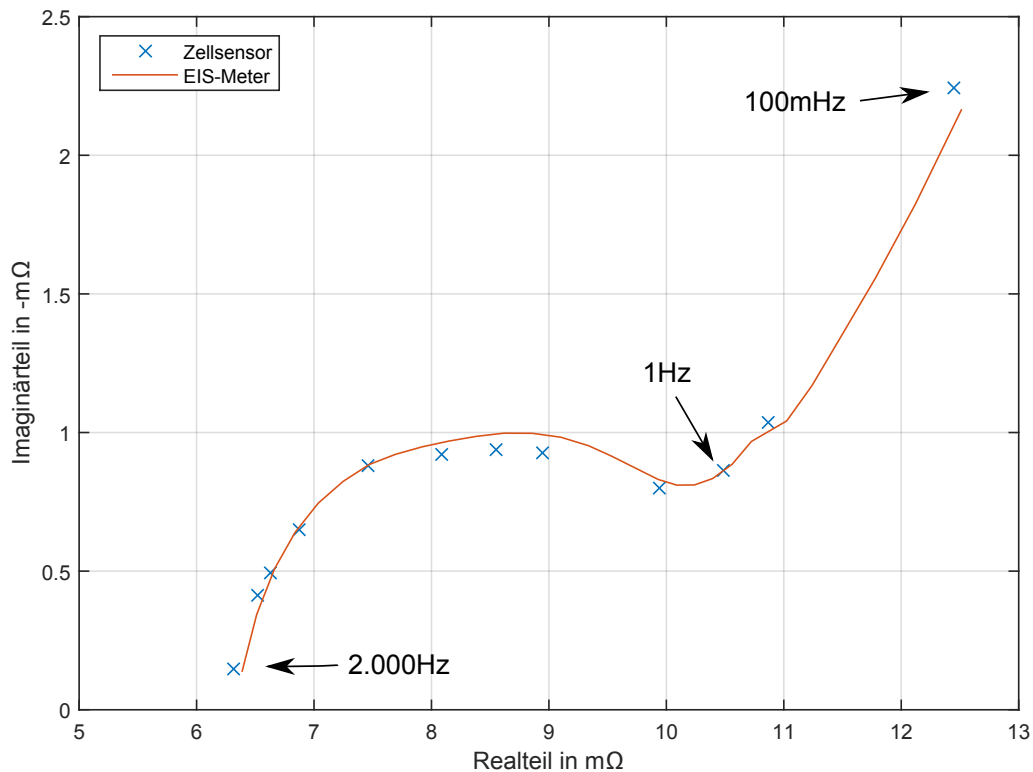


Abbildung 6.27.: Vergleich einer Impedanzmessung zwischen einem Labormessgerät und einer Messung mittels des Zellsensors. Dabei wurden Frequenzen zwischen 100 mHz und 2 kHz gewählt

Zu sehen ist, dass sich die Messwerte des FuelCon TrueData-EIS und die, durch das Messsystem aufgenommenen Messwerte sehr gut annähern. Es existieren lediglich geringe Abweichungen. Die größte Abweichung liegt bei dieser Messung im Messpunkt bei 100 mHz. Ob diese Abweichung durch eine Ladungsveränderung in der Batteriezelle oder durch einen Messfehler hervorgerufen wird, kann allerdings nicht festgestellt werden.

Das Auswertungsskript der ermittelten Messdaten dieser Messung ist in Anhang M zu finden.



Die Reproduzierbarkeit dieser Messung ist in Abbildung 6.28 zu sehen. Dabei handelt es sich um eine andere Batteriezelle des gleichen Typs als in der Messung zuvor. Es wurden wieder dieselben Frequenzpunkte aus der Tabelle 6.3 und dieselbe Anregung gewählt.

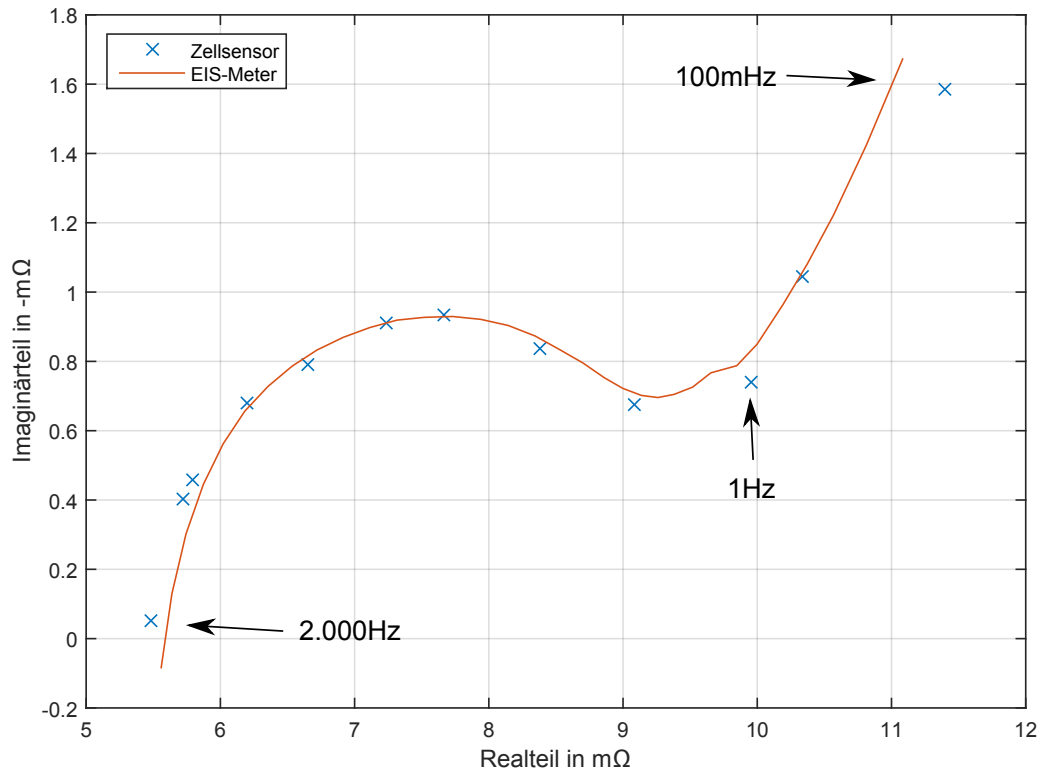


Abbildung 6.28.: Weiterer Vergleich einer Impedanzmessung zwischen einem Labormessgerät und einer Messung mittels des Zellsensors. Dabei wurden Frequenzen zwischen 100 mHz und 2 kHz gewählt

Auch diese Messung deckt sich wieder sehr gut mit der Messung des FuelCon TrueData-EIS. Eine Abweichung ist auch hier wieder im Frequenzpunkt 100 mHz zu sehen. Es bleibt unklar, ob es sich um eine Messungenauigkeit oder einen Effekt, bedingt durch einen unterschiedlichen Ladezustand der gemessenen Batteriezelle, handelt.

Eine weitere Ungenauigkeit gibt es in den höheren Frequenzpunkten oberhalb von 750 Hz. Dabei liegt der gemessene Imaginärteil der Messung etwas zu hoch. Dies ist ein Anzeichen, dass die Synchronisationszeit von  $79,12 \mu s$  etwas zu groß ist.

Diese Messungen zeigen, dass das in dieser Arbeit entwickelte Messsystem in der Lage ist, eine funksynchronisierte elektrochemische Impedanzspektroskopie direkt an der Batteriezelle durchzuführen und dabei vergleichbare Messwerte wie mit einem Labor-Messgerät zu liefern.

### 6.3.2. Messungen an gealterten Batteriezellen

Um zu überprüfen, ob das entwickelte Messsystem auch in der Lage ist, eine Veränderung der Batteriezellen durch Alterung zu messen, wurde eine Batteriezelle in verschiedenen kalendarischen Alterungsstufen vermessen. Dazu ist eine  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle (A123 Typ: ANR26650M1-B) über einen Zeitraum von ca. 5,5 Monaten bei Zimmertemperatur (ca.  $20^\circ\text{C}$ ) gelagert und dreimal vermessen worden. Dabei zeigte sich eine Veränderung des Impedanzspektrums. Die dabei gemessenen Spektren mit dem FuelCon TrueData-EIS zeigt Abbildung 6.29.

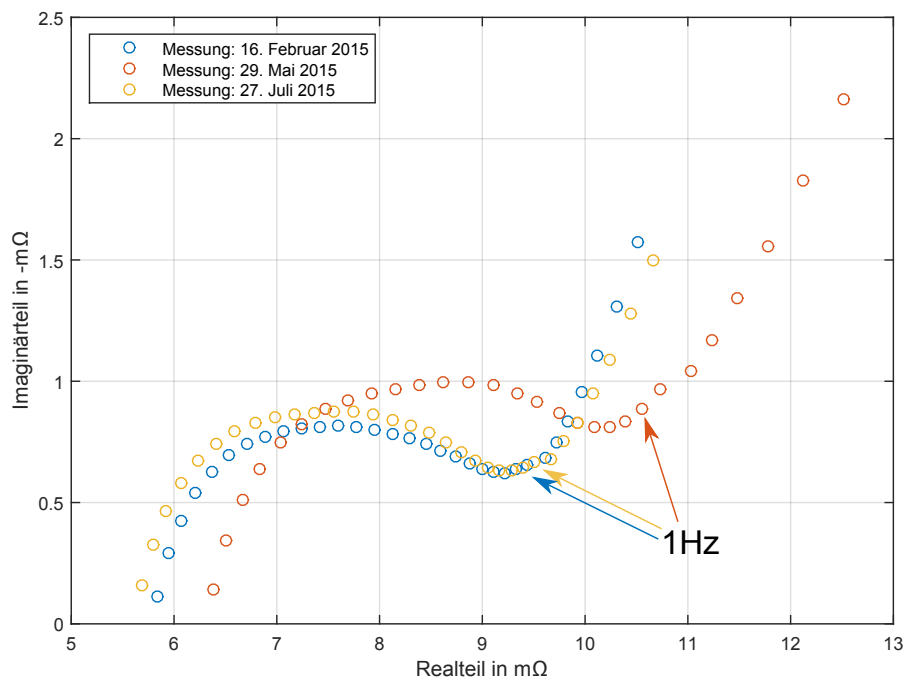


Abbildung 6.29.: Kalendarisch gemessene Alterung einer  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle

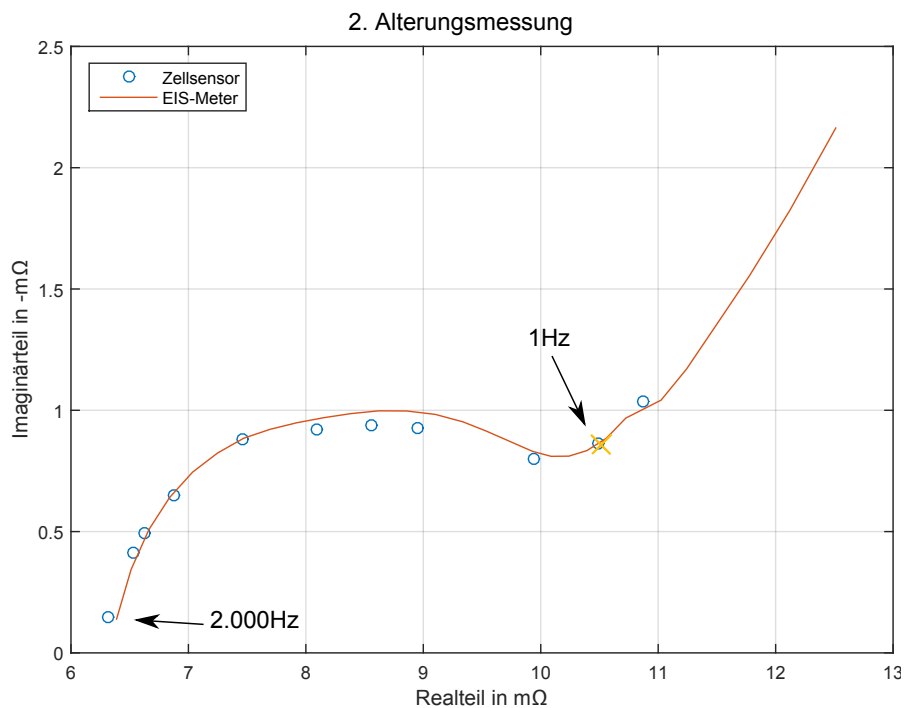
Allerdings veränderte sich das Impedanzspektrum nicht wie bei der künstlichen Alterung (siehe Anhang D) mit einer Erhöhung des Realteils bei zunehmendem Alter. Vergleichspunkt ist hierbei der Messpunkt um 1 Hz. Die Initialmessung am 16. Februar 2015 und die Messung am 29. Mai 2015 verhalten sich dabei wie erwartet. Bei der Messung am 27. Juli 2015 ist der Realteil der Impedanzmessung allerdings wieder geringer. Das Impedanzspektrum blieb trotz mehrfacher Messungen gleich. Die Ursache, welches diesen Effekt auslöst, wurde nicht weiter untersucht, da diese vermutlich durch zellinterne chemische Reaktionen hervorgerufen wird. Wichtig hierbei ist, dass sich die beiden Impedanzspektren verändert haben und diese Veränderung gemessen werden kann.

Für die Alterungsmessung mit den Zellsensoren wurden die in der Tabelle 6.4 stehenden Messpunkte, gewählt. Es wurde auf den Messpunkt bei 100 mHz verzichtet, da dieser keine Aussagekraft mehr über die Alterung der Zelle liefert und um die benötigte Messzeit zu verkürzen.

Tabelle 6.4.: Frequenzpunkte der Alterungsmessung

Messpunkt	Signalfrequenz	Burstfrequenz
1	0,5 Hz	100,0 Hz
2	1,0 Hz	200,0 Hz
3	5,0 Hz	200,0 Hz
4	10,0 Hz	500,0 Hz
5	50,0 Hz	2.000,0 Hz
6	100,0 Hz	2.000,0 Hz
7	250,0 Hz	8.000,0 Hz
8	500,0 Hz	8.000,0 Hz
9	750,0 Hz	8.000,0 Hz
10	1.000,0 Hz	8.000,0 Hz
11	2.000,0 Hz	8.000,0 Hz

Bei der Initialmessung am 16. Februar 2015 waren die Zellsensoren noch in der Entwicklung, weshalb diese Messung nicht mit diesen Sensoren durchgeführt werden konnte. Die Messung von 29. Mai 2015 hingegen konnte bereits mit dem Messsystem erfasst werden. Ein Vergleich dieser Messungen mit den Messwerten des FuelCon TrueData-EIS zeigt Abbildung 6.30.

Abbildung 6.30.: 2. Alterungsmessung einer LiFePO<sub>4</sub>-Zelle am 29. Mai 2015

Die Messung lässt erkennen, dass es nur minimale Abweichungen zwischen der Messung des FuelCon TrueData-EIS und der Messung der Zellsensoren gibt. Sehr gut stimmen hier die Frequenzpunkte beider Messungen um 1 Hz überein (gelbes Kreuz in Abbildung 6.30).

Die 3. Alterungsmessung konnte ebenfalls mit dem Messsystem durchgeführt werden. Auch hier stimmen die Messwerte wieder gut überein. Der Messpunkt um 1 Hz ist hier wieder mit einem gelben Kreuz in Abbildung 6.31 markiert. Auffällig bei dieser Messung ist, dass der Imaginärteil der Messpunkte etwas zu hoch liegt. Besonders der Messpunkt bei 2.000 Hz liegt ca. um  $0,25\text{m}\Omega$  im Real- und Imaginärteil vom Messwert des FuelCon TrueData-EIS verschoben.

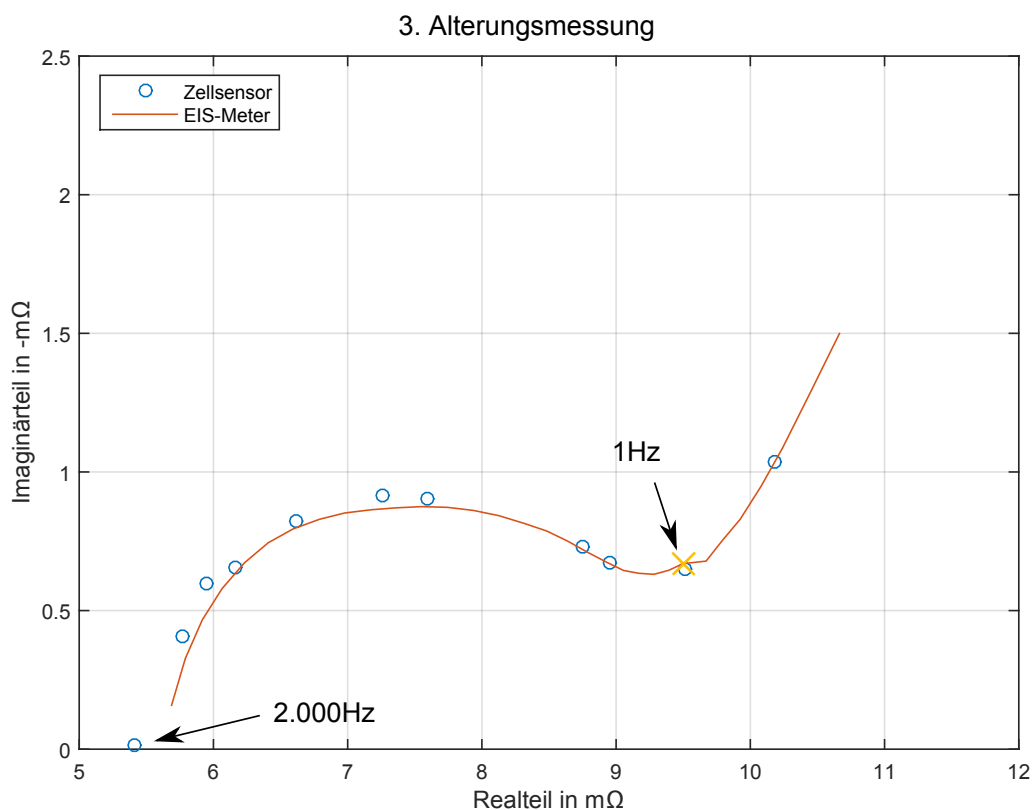


Abbildung 6.31.: 3. Alterungsmessung einer  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle am 27. Juli 2015

In der Abbildung 6.32 sind die gemessenen Impedanzspektren nochmals gegenübergestellt. Der Vergleich macht deutlich, dass die Alterung bzw. die Zustandsänderung der Zelle durch das Verfahren der funksynchronisierten Impedanzspektroskopie messbar ist. Es ergeben sich nur wenige Abweichungen zwischen den beiden Messungen. Dabei lässt sich aber nicht genau feststellen, ob es sich um Messfehler oder um eine Zustandsänderung, verursacht durch eine Ladungsänderung, handelt.

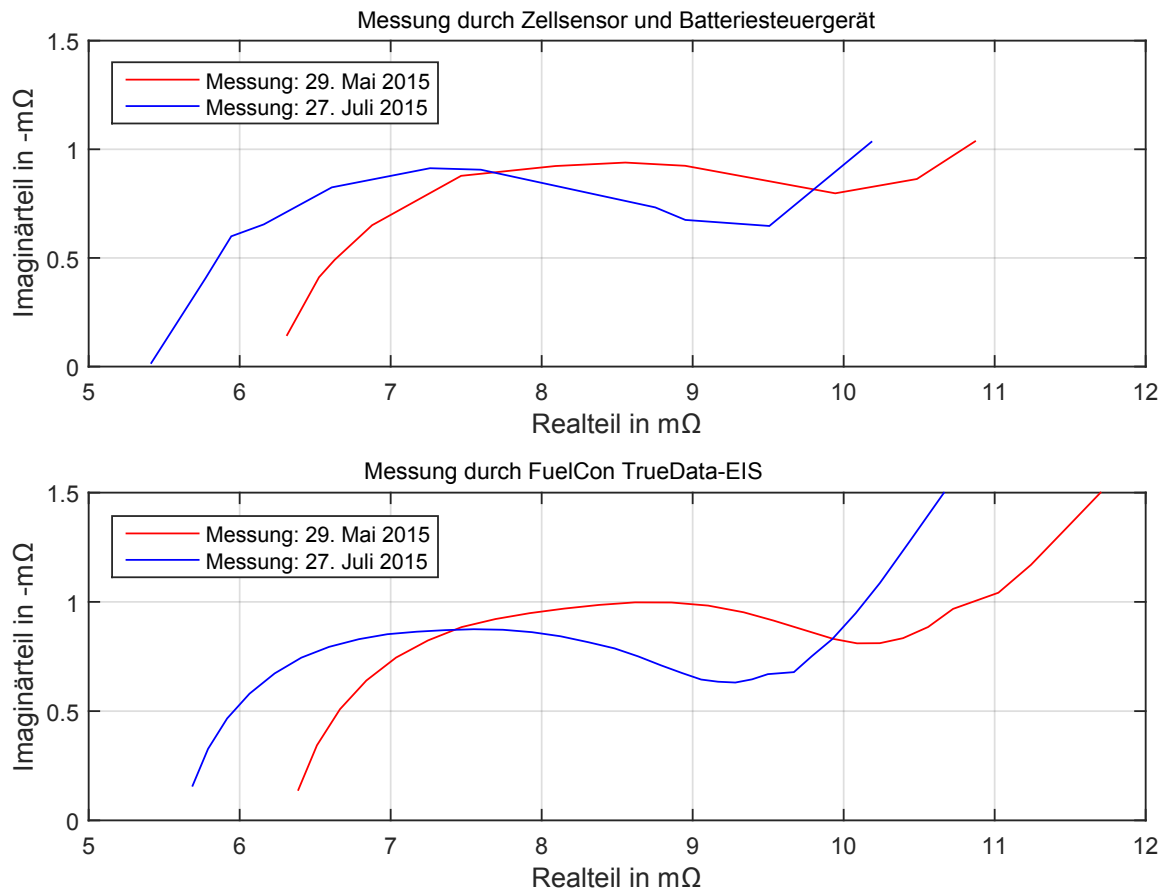


Abbildung 6.32.: Vergleich der gemessenen Impedanzspektren

### 6.3.3. Impedanzmessung bei verschiedenen Ladezuständen

Nun soll noch geprüft werden, ob das entwickelte Messsystem in der Lage ist, ein durch Ladungsveränderung unterschiedliches Impedanzspektrum zu messen. Dazu wurde die  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle (A123 Typ: ANR26650M1-B) in unterschiedlichen Ladezuständen vermessen. Hierfür wurde zunächst das Impedanzspektrum in unterschiedlichen Ladezuständen durch das FuelCon TrueData-EIS gemessen, welche in Abbildung 6.35 zu sehen sind.

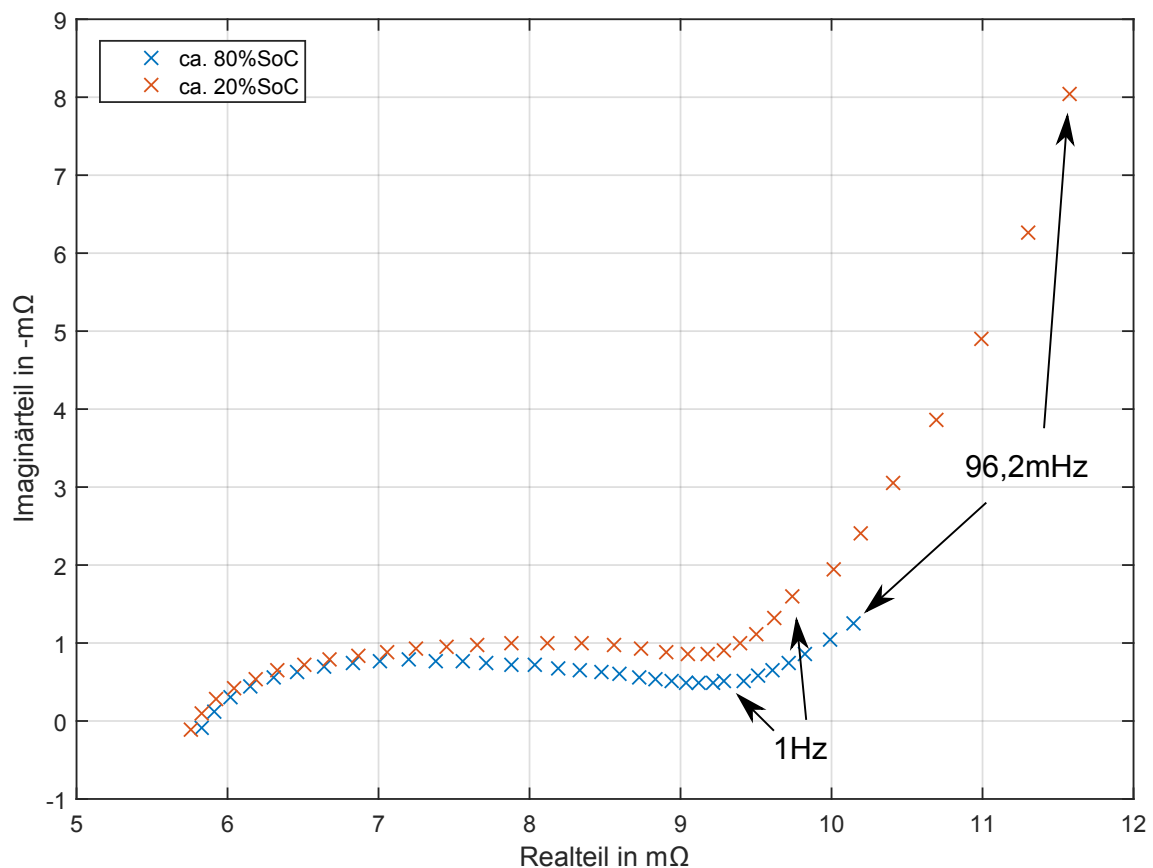


Abbildung 6.33.: Impedanzmessung bei verschiedenen Ladezuständen mit dem FuelCon TrueData-EIS

Die dargestellten Impedanzspektren zeigen die Batteriezelle bei ca. 80% und bei ca. 20% ihres Ladezustandes (mehr Ladezustände in Anhang E). Dabei ist, besonders bei den niedrigen Frequenz-Messpunkten  $< 1$  Hz, eine Veränderung im Real- wie auch im Imaginärteil zu erkennen. Beide steigen, in Abhängigkeit der Anrefrequenz, stark an. Dieses Verhalten soll nun an einer anderen Batteriezelle gleichen Typs, mit den Zellsensoren und dem Batteriesteuergerät gemessen werden.

Diese Messungen mit dem eigenen Messsystem zeigt Abbildung 6.36. Dabei wurden wieder die Frequenz-Messpunkte zwischen 2 kHz und 100 mHz aus Tabelle 6.3 mit den dazugehörigen Burstfrequenzen gewählt. Für diese Messung wurde eine andere Batteriezelle gleichen Typs verwendet, weshalb kleine Abweichung im Realteil der Impedanz zu sehen sind. Es ist aber zu erkennen, dass das gemessene Impedanzspektrum dasselbe Verhalten zeigt, wie die Messung mit dem FuelCon TrueData-EIS. Auch hier steigt der Real- und Imaginärteil der Impedanz in Abhängigkeit des Ladezustandes wieder stark an.

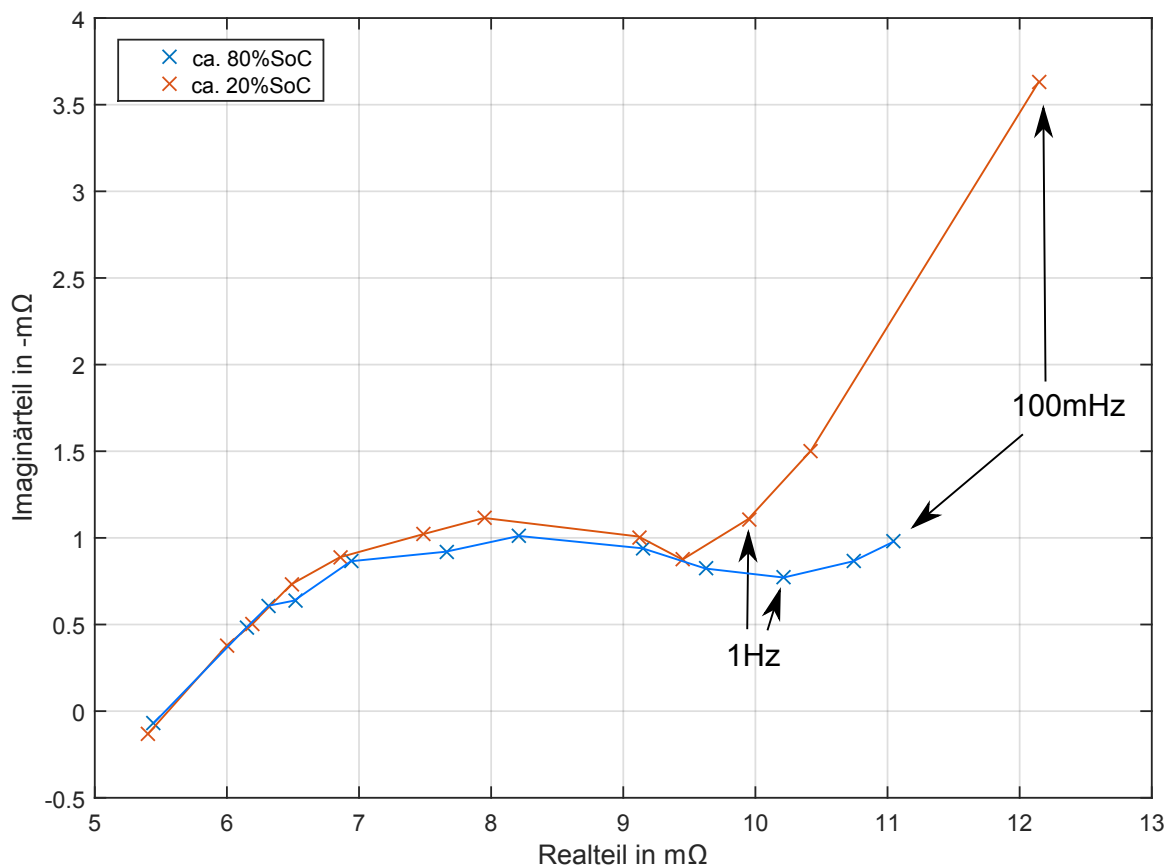


Abbildung 6.34.: Impedanzmessung bei verschiedenen Ladezuständen mit dem entwickelten Messsystem

Es zeigt sich, dass die entwickelte Hard- und Software in der Lage ist, Veränderungen der Zellchemie zu erfassen, die sich in Abhängigkeit des Ladezustands der Zelle verändern.

### 6.3.4. Impedanzmessung bei verschiedenen Temperaturen

Im Folgenden werden Messungen in unterschiedlichen Temperaturbereichen gezeigt. Verglichen werden hier wieder die Messungen mit dem FuelCon TrueData-EIS und den Messwerten aus dem, in dieser Arbeit entwickelten Messsystem. Es wurde darauf geachtet, dass bei den Messungen ungefähr der gleiche Ladezustand von ca. 80% SoC vorhanden war.

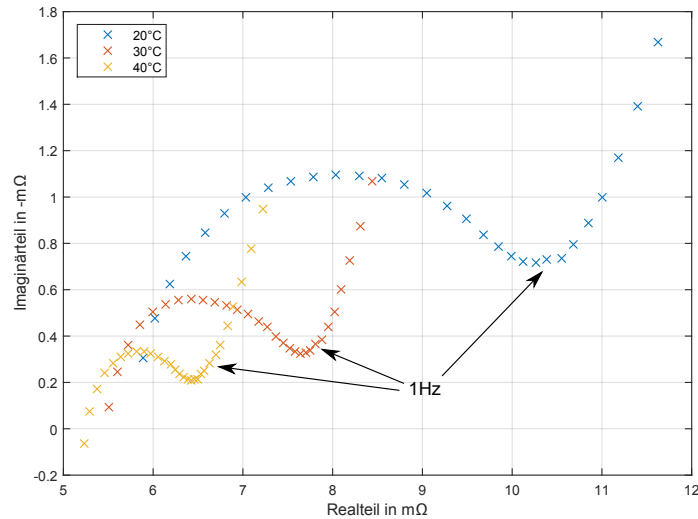


Abbildung 6.35.: Impedanzmessung bei verschiedenen Temperaturen: Gemessen mit FuelCon TrueData-EIS

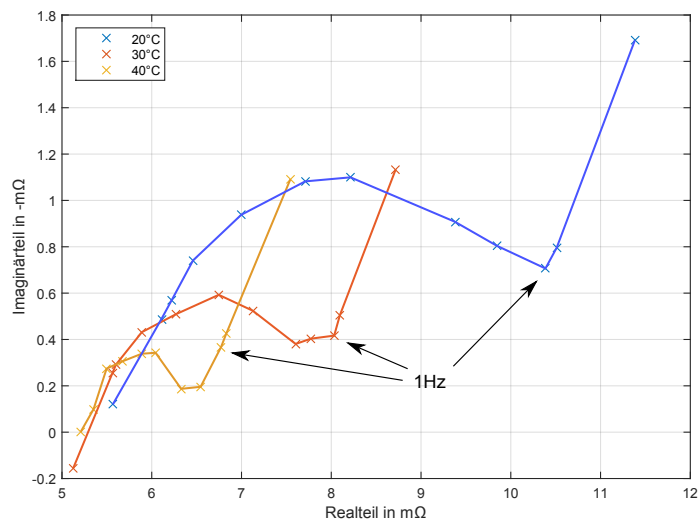


Abbildung 6.36.: Impedanzmessung bei verschiedenen Temperaturen: Gemessen mit dem entwickelten Messsystem



Die Messungen zeigen, dass auch Unterschiede der Zelltemperatur sehr gut erfasst werden können. Beide Messungen zeigen bei den unterschiedlichen Temperaturen das gleiche Verhalten. Besonders auffällig bei dieser Messung ist das "Wandern" des 1 Hz Frequenz-Messpunkts, weg vom Wendepunkt des Impedanzspektrums in Richtung des Diffusionsastes. Allerdings ist bei allen drei Messungen der Frequenz-Messpunkt vom 2.000 Hz leicht verschoben. Dies deutet wieder darauf hin, dass die gewählte Synchronisationszeit noch nicht optimal ist.

## 6.4. Auswertung und Bewertung der Messergebnisse

Die Ergebnisse der vorangegangenen Messungen bestätigen, dass es möglich ist, eine funksynchronisierte elektrochemische Impedanzspektroskopie mit den entwickelten Zellsensoren durchzuführen. Alle Messungen konnten mit dem FuelCon TrueData-EIS Labormessgerät bestätigt werden.

Dennoch kam es bei den Messungen besonders bei hohen Frequenz-Messpunkten zu leichten Abweichungen im Imaginärteil der Impedanz, welche meist über den Messwerten des FuelCon TrueData-EIS lagen. Dies deutet darauf hin, dass die eingestellte Synchronisationszeit von  $79,12 \mu\text{s}$  zu hoch ist. Der vorhandene Synchronisationsfehler lässt sich mit den aufgenommenen Daten berechnen.

Dazu werden die Messdaten der Temperaturmessung bei  $40^\circ\text{C}$  bei 2 kHz genommen. Dabei stimmt der Realteil nahezu überein. Der Imaginärteil hat eine Abweichung von  $0,06 \text{ m}\Omega$ .

Tabelle 6.5.: Messdaten der Temperaturmessung bei  $40^\circ\text{C}$

	Messdaten bei 2 kHz
FuelCon TrueData-EIS	$5,23 \text{ m}\Omega + j 0,06 \text{ m}\Omega$
entwickeltes Messsystem	$5,20 \text{ m}\Omega + j 0,00 \text{ m}\Omega$

Die Messwerte haben eine Phasenverschiebung von  $0,657^\circ$ . Mit diesem Wert lässt sich die zeitliche Abweichung  $\Delta_t$  der beiden Messwerte zu  $0,9125 \mu\text{s}$  bestimmen.

$$\Delta_t = \frac{1}{360^\circ} \cdot \frac{1}{2 \text{ kHz}} \cdot 0,657^\circ = 0,9125 \mu\text{s} \quad (6.9)$$

Die Abweichung befinden sich noch innerhalb der Toleranzzeit von  $1,388 \mu\text{s}$ , welche in der Analyse im Abschnitt 3.3 ermittelt wurde. Da dieser Fehler in den meisten Messungen vorkommt, kann auch eine Anpassung der Synchronisationszeit vorgenommen werden. Diese Anpassung muss dann durch weitere Messungen überprüft werden.

Die Abweichung des Realteils bei hohen Frequenz-Messpunkten kann nicht von einem Synchronisationsfehler stammen, da sich ein Synchronisationsfehler kaum im Realteil des Messwertes bemerkbar macht. Dies lässt sich durch die Berechnung aus der Analyse im Abschnitt 3.3 bestätigen. Dieser Fehler entsteht durch einen Kalibrierungsfehler des AD-Wandlers.

Es zeigt sich mit diesen Messungen, dass Aussagen über den Zustand der Batteriezelle gemacht werden können. Zu sehen ist aber auch, dass die Messungen eine begrenzte Genauigkeit haben. So ergaben die Messungen, dass Vorgänge wie die Temperaturmessung, die eine große Änderung des Spektrums bewirken, sich sehr gut messen lassen. Ebenfalls konnten Ladungsänderungen an den Zellen gut erfasst werden. Dabei zeigte sich, dass der Betrag der Impedanz bei kleiner werdender Ladung und kleiner Anregefrequenz stark ansteigt. Dies könnte als Indikator für eine Ladungsdiagnostik der Batteriezelle dienen. Inwieweit sich diese Messungen mit den gleichen Ergebnissen wiederholen lassen, müssen aber weitere Tests zeigen.

Ebenso konnte die Alterung der Batteriezelle gemessen werden. Auch wenn diese nicht den theoretischen Vorstellungen entsprach, konnten die Messwerte des FuelCon TrueData-EIS durch das entwickelte Messsystem nachgewiesen werden. Dies zeigt, dass auch eine fortschreitende Alterung durch die funksynchronisierte Impedanzmessung messbar ist.

Die Anwendung der funksynchronisierten Impedanzspektroskopie mit dem jetzigen Stand der Hard- und Software ist möglich. Es muss aber darauf geachtet werden, dass es besonders im höheren Frequenzbereich zu Abweichungen im Real- und Imaginärteil kommen kann.

Mit diesem Stand können nun auch die eingangs erwähnten Forschungsfragen aus Abschnitt 1.2 beantwortet werden. Die Frage, ob die Messelektronik für die EIS-Messung soweit optimiert werden kann, dass es möglich ist, diese auf einem Zellsensor unterzubringen zu können, kann mit ja beantwortet werden. Durch die analoge Vorverarbeitung ist es gelungen, den internen 12 Bit AD-Wandler für die Messung der Wechselspannung an der Batteriezelle zu verwenden, ohne aufwendige Messelektronik einzusetzen.

Auch die Frage, ob es über die drahtlose Schnittstelle möglich ist, eine ausreichende Synchronisation der Strom- und Spannungswerte herzustellen, wurde untersucht und beantwortet. Innerhalb der festgelegten Toleranzen konnte erfolgreich eine Synchronisation der Strom- und Spannungswerte durchgeführt werden. Durch die ausreichende Synchronisierung gelang es dann auch vergleichbare Messungen zwischen dem FuelCon TrueData-EIS und dem in dieser Arbeit entwickelten Messsystem aufzunehmen.

Ebenfalls konnten Messungen bei unterschiedlichen Alterungs- und Ladezuständen sowie bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt werden. Die Messungen folgten alle den erwarteten Impedanzkurven.

# 7. Zusammenfassung und Ausblick

## 7.1. Zusammenfassung der Arbeit

In dieser Arbeit konnte erfolgreich ein Messsystem zur funksynchronisierten elektrochemischen Impedanzspektroskopie an Batterie-Zellen entwickelt werden. Neben dieser Entwicklung wurden theoretische Grundlagen zur elektrochemischen Impedanzspektroskopie vorgestellt, welche einen Überblick über die in der Batteriezelle herrschenden chemischen Vorgänge geben, die für das Verständnis zur Impedanzspektroskopie notwendig sind. Besonders wurden Vorgänge beschrieben, die für eine Impedanzänderung der Zelle verantwortlich sind. Anhand dieser Impedanzänderungen wurde ein Batteriemodell erstellt, welches das theoretische Impedanzspektrum beschreibt.

Da es bereits einige Vorarbeiten zu dem Thema der funksynchronisierten Impedanzspektroskopie gab, wurde zunächst ein Überblick über die vorhandene Hard- und Software gegeben. Nach einer Analyse konnte festgestellt werden, dass die bisherigen Zellsensoren nicht in der Lage sind, eine vollständige funksynchronisierte Impedanzspektroskopie innerhalb des nötigen Frequenzbereichs durchzuführen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, einen neuen Zellsensor zu entwickeln, mit dem der nötige Frequenzbereich für eine vollständige Impedanzspektroskopie erreicht werden kann.

Durch das, in den theoretischen Grundlagen vorgestellte Batteriemodell, konnten Kriterien für die Entwicklung eines neuen Messsystems erarbeitet werden. Daraufhin konnte eine Konzeptionierung der nötigen Hardware durchgeführt und berechnet werden. Es wurde beschlossen, dass bisherige Konzept der Messung mittels hochauflösendem AD-Wandler zu verlassen und ein Konzept mit analoger Vorverarbeitung des Messsignals zu verfolgen. Dadurch wurde es möglich, das Messsignal mit dem internen 12 Bit AD-Wandler des eingesetzten Mikrocontrollers CC430F5137 zu messen. Weiter wurde die Software des Zellsensors um wichtige Funktionen, die für die Optimierung der Datenübertragung und der Impedanzspektroskopie nötig sind, erweitert. So konnte erfolgreich eine Laufzeitmessung implementiert werden, mit deren Hilfe Abweichungen in der Synchronisation zwischen Batteriesteuergerät und den Zellsensoren detektiert werden können. Ebenso konnte eine verteilte Signalverarbeitung auf den Zellsensoren implementiert werden, wodurch das anfallende Datenvolumen innerhalb des Funkkanals erheblich reduziert werden konnte.

Neben der Neuentwicklung eines Batteriesteuergerätes mit drahtloser Kommunikationsschnittstelle und einer Möglichkeit zur Messung des Stroms, wurde der Zellsensor um die analoge Vorverarbeitung erweitert und ein neuer Zellsensor gefertigt. Dabei konnten die Funkeigenschaften des Sensors durch eine Simulation mit dem 3D FEM-Simulationsprogramm CST Microwave Studio untersucht und optimiert werden. Ergebnis dieser Simulation war eine wesentlich bessere Abstrahleigenschaft des Zellsensors.

Bei der Inbetriebnahme wurden alle neu entwickelten Funktionen überprüft. Dabei konnten keine Fehlfunktionen festgestellt werden. Durch die Vermessung einer Testimpedanz zeigte sich, dass sich die aus der Analyse ergebene theoretische Synchronisationszeit, die sich zwischen der Strom- und Spannungsmessung befindet, höher ist als ursprünglich angenommen. Eine Analyse des gesamten Messsystems ergab, dass zwischen Strom- und Spannungserfassung eine Phasenverschiebung herrscht. Nachdem diese ausgeglichen war, konnten mit dem entwickelten System erste Messergebnisse erzielt werden, die mit denen eines Labormessgerätes vergleichbar sind.

Nach den erfolgreichen Messungen an einer Testimpedanz wurden erste Messreihen an einer  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle durchgeführt. Dabei wurden Messungen an unterschiedlichen Alterungszuständen, verschiedenen Ladezuständen sowie bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt. Die Messergebnisse der einzelnen Messreihen stimmten gut mit den Vergleichsmessungen des Labormessgeräts überein.

## 7.2. Ausblick

Die ersten Messungen mit der entwickelten funksynchronisierten Impedanzspektroskopie zeigten gute Ergebnisse. Der Zellsensor ist in Kombination mit dem Batteriesteuergerät nun auch in der Lage, eine elektrochemische Impedanzspektroskopie an  $\text{LiFePO}_4$ -Zellen durchzuführen. Dabei konnten alle Punkte der geforderten Aufgabenstellung (Anhang I) bearbeitet werden. Das entwickelte Messsystem kann nun weiter intensiv erprobt und getestet werden. Interessant wäre eine Erprobung über einen längeren Zeitraum an alternden Zellen, welche in dieser Arbeit wegen der benötigten Zeit für die Alterung nur bedingt durchgeführt werden konnte. Ebenso ist eine Erprobung an unterschiedlichen Batterietypen durchzuführen. Die in dieser Arbeit gezeigten Messungen wurden alle an einer A123 (Typ: ANR26650M1-B)  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle durchgeführt.

Untersucht werden muss noch die Veränderung der Synchronisationszeit bei unterschiedlichen Verstärkungsstufen der analogen Vorverarbeitung. Die aufgenommene Messung in Abbildung 6.22 zeigt den Amplituden- und Phasengang bei einer Verstärkung von  $V = 10,765$ . Vermutet wird, dass es bei unterschiedlichen Verstärkungsstufen zu unterschiedlichen Phasengängen kommt. Dies verändert wiederum die nötige Synchronisationszeit, die zwischen Taktaussendung und Strommessung liegen muss. Werden unterschiedliche Phasengänge

festgestellt, so kann die nötige Synchronisationszeit als Wert im Batteriesteuergerät hinterlegt und entsprechend der Verstärkungsstufe gewählt werden.

Es bleiben aber noch mehr offene Punkte, die für weiterführende Arbeiten geeignet sind.

### **Spannungsversorgung**

Die eigenständige Spannungsversorgung des Zellsensors stellt momentan das Hauptproblem dar um einen unabhängigen Betrieb von externen Spannungsquellen zu gewährleisten. In Anhang B wird ein möglicher Lösungsansatz diskutiert, womit die 3,3 V Versorgungsspannung während der Abschaltung des TPS61201 stabilisiert werden kann. Dieser Lösungsansatz muss aber aufgrund der dadurch reduzierten maximalen Abtastrate von 2 kHz nochmals überarbeitet werden, sodass auch höhere Abtastraten möglich werden.

Generell sollte über eine Überarbeitung der Zellspannungsversorgung nachgedacht werden. So würde eine Anhebung der 3,3 V Versorgungsspannung mehrere existierende Probleme lösen. Es könnte zum einen der Gleichspannungsabzug an der Subtrahierschaltung erhöht werden. Dadurch ließe sich das zu messende Spannungssignal einer voll geladenen  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle deutlich mehr verstärken als das bisher möglich ist. Bisher können max. 3,26 V abgezogen werden, wodurch die Verstärkung begrenzt wird.

Zum anderen könnte durch eine Spannungsanhebung eine separate Versorgungsspannung über einen LDO für den Analogteil des Zellsensors aufgebaut werden. Um die Energiebilanz des Zellsensors nicht unnötig zu erhöhen, könnte dieser LDO vom Mikrocontroller gesteuert werden und nur bei Bedarf die Spannung für den Analogteil erzeugen.

Dazu könnte der TPS61200 von Texas Instruments genutzt werden. Dieser ist baugleich zum momentan eingesetzten TPS61201, der eine feste Ausgangsspannung von 3,3 V besitzt. Am TPS61200 lässt sich die Ausgangsspannung zwischen 1,8 V bis 5,5 V einstellen.

### **Kalibrierung und Untersuchung des Phasen- und Amplitudengangs**

Für genauere Messergebnisse muss eine Spannungskalibrierung des AD-Wandlers auf dem Zellsensoren sowie auf dem Batteriesteuergerät durchgeführt werden. Zudem sollte der Amplitudengang der analogen Vorverarbeitung bei unterschiedlichen Verstärkungsstufen untersucht werden. Ebenso wie der Phasengang wird sich der Amplitudengang bei unterschiedlichen Verstärkungsstufen verändern.

### **Automatische Einstellung der analogen Vorverarbeitung**

Softwaretechnisch sollte die Steuerung der automatischen Einstellung der analogen Vorverarbeitung optimiert werden. Momentan werden die zu erreichenden Grenzspannungen, durch die Einstellung der Rheostaten und anschließender Messung der Spannung schrittweise angenähert. Dies kann bei dem derzeit verwendeten Algorithmus, wenn alle Schrittstufen des Rheostaten durchlaufen werden müssen, bis zu 40,96 s dauern. Durch einen besseren Algorithmus der Annäherung könnte diese Zeit deutlich verkürzt werden.

So könnte z.B. das Wägeverfahren angewandt werden, um die Grenzspannungen schneller zu erreichen und die Einstellzeit zu verkürzen.

### **Synchronisation zwischen den Zellsensoren**

Des Weiteren muss noch eine Betrachtung der Synchronität zwischen den Sensoren gemacht werden. Erste Messungen ergaben, dass der Unterschied der einzelnen Zellsensoren im Durchschnitt 206,9 ns beträgt [70]. Diese Messung wurde aber mit den Zellsensoren aus der Arbeit [48] durchgeführt und sollte mit den neuen Zellsensoren wiederholt werden. Da die selbe Hardware verwendet wurde, ist aber mit keiner größeren Abweichung zu den gemessenen Werten zu rechnen.

### **Erkennung einer Messung im nichtlinearen Bereich**

Das Problem, dass mit der Messung einer Nichtlinearität einhergeht, wurde innerhalb dieser Arbeit bereits erarbeitet. Allerdings wurde nicht untersucht, wie sich solche fehlerhaften Messungen detektieren lassen. Eine Lösung für die Detektion einer solchen nichtlinearen Messung ist die Beobachtung der höheren Harmonischen der Anregfrequenz. Durch die Literatur ist bekannt, dass bei Messungen an Nichtlinearitäten neben der Grundschwingung der Anregfrequenz auch Harmonische Vielfache dieser Schwingung im Frequenzspektrum auftauchen. So lässt sich die Linearität der Impedanzmessung durch das Beobachten höherer Harmonischer der Anregungsfrequenz detektieren und bewerten [42]. Diese Möglichkeit könnte leicht in das Messsystem implementiert werden, da die nötige Signalverarbeitung bereits durch den Goertzel-Algorithmus auf dem Zellsensor und dem Batteriesteuergerät vorhanden ist.

### **Konzeption einer Anregung**

Als weiteren Arbeitspunkt kann die Konzeption einer eigenen Anregung gesehen werden. Diese kann idealerweise durch das Batteriesteuergerät gesteuert werden. Innerhalb dieser Arbeit wurde als Anregequelle meist das FuelCon TrueData-EIS genutzt. Um das Messsystem unabhängig von diesem Labormessgerät betreiben zu können, ist aber eine eigene Anregung nötig.

### **Optimierung der verteilten Signalverarbeitung**

Die verteilte Signalverarbeitung lässt sich dahingehend optimieren, dass die Berechnung des rekursiven Filterteils des Goertzel-Algorithmus zwischen den einzelnen Spannungsmessungen der Burstmessung auf dem Zellsensor stattfinden kann. Dadurch wäre nur noch ein minimaler Speicher für die Filter-Verzögerungsstufen notwendig, der bei jeder neuen Messung überschrieben werden können. Der bisherige verwendete Speicher für die 2.500 Spannungswerte würde dadurch nicht mehr benötigt werden, da die Messwerte direkt nach ihrer Aufnahme in der Filterstruktur verarbeitet werden könnten und weiter nicht mehr benötigt werden. Voraussetzung dafür ist eine schnelle Verarbeitung der Messdaten. So wäre die für die Verarbeitung zur Verfügung stehende Zeit abhängig von der verwendeten Burstrate, abzüglich der Zeit, die für die Spannungsaufnahme nötig ist.

Ob die Verarbeitung des Mikrocontrollers schnell genug ist, um auch bei höheren Burstfrequenzen schnell genug die Berechnung durchführen zu können, müssen Messungen in weiterführenden Arbeiten zeigen.

# Tabellenverzeichnis

2.1. Übersicht der Kathodenmaterialien (nach [68]) . . . . .	15
2.2. Übersicht der Bauteiländerungen bei Alterung . . . . .	45
3.1. Übersicht kommerzieller EIS-Meter . . . . .	54
3.2. Übersicht Innenwiderstand . . . . .	56
3.3. Bewertungsmatrix AD-Wandler Auswahl . . . . .	70
3.4. Übersicht verschiedener Digital-Analog-Wandler . . . . .	71
3.5. Vergleich der beiden vorgestellten Messkonzepte . . . . .	78
3.6. Aufwandsvergleich der DFT-Berechnung . . . . .	87
3.7. Mindestanforderung der Impedanzspektroskopie . . . . .	88
4.1. Tabelle der eingesetzte IC-Bauelemente . . . . .	101
5.1. Funktionsübersicht Zellsensor v0.4 . . . . .	107
5.2. Vergleich der entwickelten Goertzel-Filterstruktur . . . . .	123
6.1. Vergleich der Ergebnisse der Laufzeitmessung . . . . .	136
6.2. Frequenz-Messpunkte der Testimpedanz-Messung . . . . .	140
6.3. Frequenzpunkte der gemessenen Impedanzspektroskopie . . . . .	147
6.4. Frequenzpunkte der Alterungsmessung . . . . .	151
6.5. Messdaten der Temperaturmessung bei 40 °C . . . . .	157
F.1. Befehlsübersicht für das Batteriesteuergerät . . . . .	206

# Abbildungsverzeichnis

1.1. Prinzip der Zellüberwachung und des Batteriemangements (ent. aus [62]) . . . . .	9
2.1. Potenzialbereich verschiedener Aktivmaterialien (nach [72]) . . . . .	13
2.2. Prinzipieller Aufbau einer LiFePO <sub>4</sub> Zelle (nach [72] [61]) . . . . .	14
2.3. Überspannungen an einer Zelle im Ladefall (nach [68]) . . . . .	17
2.4. Ohmsche Überspannung am Batteriemodell . . . . .	18
2.5. Durchtrittsüberspannung am Batteriemodell . . . . .	19
2.6. Im linken Bild ist die Butler-Volmer-Annäherung mit $i_0 = 3 \text{ A}$ , $\alpha = 0.5$ , $T = 293 \text{ K}$ und $n = 2$ zu sehen. Im rechten Bild ist der Durchtrittswiderstand in Abhängigkeit der Überspannung $\eta_{ct}$ zu sehen (nach [42]). . . . .	20
2.7. Doppelschichtmodell mit Potenzialverlauf (nach [24]) . . . . .	21
2.8. Ohmsche Überspannung: Doppelschichtkapazität . . . . .	22
2.9. Im linken Bild ist der Betrag der Impedanz $Z$ logarithmisch über der Frequenz dargestellt. Im rechten Bild ist der Imaginärteil in Abhängigkeit des Realteils aufgetragen . . . . .	23
2.10. Vollständiges Batteriemodell der drei Überspannungen . . . . .	23
2.11. Prinzip SEI-Wachstum (nach [61]) . . . . .	24
2.12. SEI Wachstum am gealterten LiFePO <sub>4</sub> Material (ent. aus [26] [45]) . . . . .	25
2.13. Aufbrechen der Graphit-Struktur (nach [26]) . . . . .	26
2.14. Tatsächliche Kapazität einer Zelle (nach [68]) . . . . .	26
2.15. Angeregtes System . . . . .	28
2.16. Typische Phasenverschiebung zwischen Anregung und Antwort . . . . .	29
2.17. Zweipol . . . . .	30
2.18. Strom-Spannungs-Zeitsignale einer komplexen Impedanz . . . . .	31
2.19. Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm . . . . .	32
2.20. Bode-Diagramm einer Impedanzspektroskopie einer LiFePO <sub>4</sub> -Zelle . . . . .	33
2.21. Nyquist-Diagramm einer Impedanzspektroskopie . . . . .	34
2.22. Nyquist-Diagramm (nach [63]) . . . . .	35
2.23. Verschiedene Batteriemodelle (nach [16]) . . . . .	38
2.24. Einfaches Batteriemodell nach Randles [58] . . . . .	39
2.25. Nyquist-Diagramm der Elektrodenimpedanz (nach [24]) . . . . .	40
2.26. Erste Abschätzung der Parameter für das Batteriemodell aus einem beispielhaften Impedanzspektrum . . . . .	41
2.27. Erweitertes Batteriemodell nach Randles [58] . . . . .	42



2.28. Nyquist-Diagramm des erweiterten Randles Batteriemodells . . . . .	43
2.29. Links: Batteriemodell mit zwei RC-Gliedern; Rechts: Batteriemodell mit vier RC-Gliedern (ent. aus [16]) . . . . .	43
2.30. Vergleich zwischen einem gemessenen Impedanzspektrum und dem vorgestellten optimiertes Batteriemodell . . . . .	44
2.31. Alterung am Batteriemodell . . . . .	46
2.32. Künstliche Alterung einer LiFePO <sub>4</sub> Zelle bei zwei verschiedenen Alterungszuständen . . . . .	47
3.1. Batteriesteuergerät mit CC1101-Transceiver Platine und Zellsensor der Klasse 3 mit hochauflösender AD-Wandler Erweiterungsplatine . . . . .	48
3.2. AD-Wandler Erweiterungsmodul (ent. aus [48]) . . . . .	50
3.3. Blockschaltbild des Zellsensors v0.4 und deren Verbindungen der Sensorklasse 3 (nach [48]) . . . . .	51
3.4. Batteriesteuergerät für Zellsensoren der Klasse 3 auf Basis eines Evaluations-Board (Olimex MSP430-169STK) . . . . .	53
3.5. Zellalterung - Einzelne Frequenzen . . . . .	55
3.6. Synchronisationsfehler zwischen Strom und Spannung um 125 ms . . . . .	58
3.7. Erste Näherung des Synchronisationsfehlers bei 2 kHz . . . . .	60
3.8. Synchronisationsfehler in Abhängigkeit der Frequenz bei unterschiedlichen Synchronisationszeiten . . . . .	61
3.9. Dynamische Laufzeitermittlung zwischen dem Batteriesteuergerät (BS) und dem Zellsensor (ZS) . . . . .	62
3.10. Kleinsignalverhalten ohne Offset: $R_{\text{Kleinsignal}} = 59,6 \text{ m}\Omega$ , $R_{\text{Großsignal}} = 25,6 \text{ m}\Omega$ : Gleichstromanteil: 0,0 A, Kleinsignalamplitude: 0,5 A, Großsignalamplitude: 5,0 A . . . . .	64
3.11. Kleinsignalverhalten mit Offset: $R_{\text{Kleinsignal}} = 8,3 \text{ m}\Omega$ , $R_{\text{Großsignal}} = 11,5 \text{ m}\Omega$ : Gleichstromanteil: 3,0 A, Kleinsignalamplitude: 0,5 A, Großsignalamplitude: 5 A . . . . .	65
3.12. Vergleich der abweichenden Impedanzspektren mit und ohne Gleichstromanteil . . . . .	65
3.13. Blockschaltbild eines SAR-AD-Wandlers (nach [67]) . . . . .	68
3.14. Schematische Darstellung der Rauschformung (nach [67]) . . . . .	69
3.15. Blockschaltbild eines Delta-Sigma-AD-Wandlers (nach [67]) . . . . .	69
3.16. Spannungs-Subtrahierschaltung . . . . .	73
3.17. Kapazität der DC-Filterung . . . . .	74
3.18. Spannungs-Subtrahierschaltung . . . . .	75
3.19. Dynamisch einstellbare Subtrahierschaltung . . . . .	76
3.20. Dynamisch einstellbare Subtrahierschaltung mit einstellbarer Verstärkung . . . . .	77
3.21. Signalfussdiagramm einer Radix-2-FFT mit der Länge $N = 8$ . . . . .	83
3.22. Filterstruktur des Goertzel-Algorithmus 1. Ordnung . . . . .	85
3.23. Filterstruktur des Goertzel-Algorithmus (nach [64]) . . . . .	86

---

3.24. Vergleich der Berechnungszeiten der Standard DFT, Radix-2-DFT und des Goertzel-Algorithmus . . . . .	87
4.1. Tiva C Series TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Board (ent. aus[36]) . . . . .	91
4.2. Layout des CC1101 Transceiver-Erweiterungsmoduls Links: Oberseite des Layouts. Rechts: Unterseite des Layouts . . . . .	92
4.3. Layout des ACS716 Strommess-Erweiterungsmoduls Links: Oberseite des Layouts. Rechts: Unterseite des Layouts . . . . .	93
4.4. Blockschaltbild des Batteriesteuergeräts . . . . .	94
4.5. Aufteilung der Zellspannung in zwei verschiedene Messpfade . . . . .	96
4.6. Auflösungsstufen des Rheostaten . . . . .	97
4.7. Dynamisch einstellbare Subtrahierschaltung mit einem zusätzlichen Widerstand nach dem Rheostaten . . . . .	97
4.8. Nichtinvertierender Messverstärker . . . . .	98
4.9. Analoge Vorverarbeitung: $R_1, R_2, R_7 = 1\text{ k}\Omega$ und $R_{\text{Rheo1}}, R_{\text{Rheo2}}, R_3-R_6 = 100\text{ k}\Omega$ . . . . .	99
4.10. Geändertes Anpassungsnetzwerk des CC430F5137 . . . . .	99
4.11. Links: externe Interruptauslösung über Ein- und Ausgängeports am Mikrocontroller; Rechts: interne Interruptauslösung durch gezielte Adressierung der Interrupt Service Routine . . . . .	100
4.12. Blockschaltbild des neu entwickelten Zellsensors . . . . .	102
4.13. Zu überarbeitende Kontaktfläche auf dem Zellsensor: Gegenüberstellung der vorhandenen Kontaktfläche zu der benötigten Kontaktfläche . . . . .	103
4.14. Layout des neuen Zellsensors: Links: Layout der Oberseite. Rechts: Layout der Rückseite. Layout in höherer Auflösung in Anhang K. . . . .	105
4.15. Layout der hochauflösenden AD-Wandler-Erweiterungsplatine Links: Layout der Oberseite. Rechts: Layout der Rückseite . . . . .	106
5.1. Speichermanagement bei 12 Bit Messwerten, Links: Normales Speichermanagement. Rechts: Optimiertes Speichermanagement . . . . .	108
5.2. Zustandsablauf und Abhängigkeiten der dynamischen Laufzeitermittlung . . . . .	109
5.3. Sendeprinzip der DCO-Kalibrierung (nach [52]) . . . . .	110
5.4. Pulsmessung des Batteriesteuergeräts . . . . .	110
5.5. Softwareablauf der DCO-Kalibrierung am Zellsensor . . . . .	111
5.6. Softwareschritte zur Einstellung mittels Gleichspannungsanteil . . . . .	112
5.7. Erste Stufe der analogen Vorverarbeitung: Gleichspannung abziehen . . . . .	113
5.8. Zweite Stufe der analogen Vorverarbeitung: Messwert verstärken . . . . .	114
5.9. Möglicher Fehler der Messwert-Verstärkung. Links: Abtastung eines 50 Hz Messsignals. Rechts: Worst-Case Abtastung eines 25 Hz Messsignals. . . . .	114
5.10. Konzeptdarstellung der verschiedenen Stufen mit Grenzspannungen der Einstellung unter Last . . . . .	115

---

5.11. Grundautomat des Batteriesteuergeräts . . . . .	116
5.12. Prioritätenverteilung am Batteriesteuergerät . . . . .	117
5.13. Unterautomat der Burstmessung zur Impedanzspektroskopie . . . . .	119
5.14. Berechnung des rekursiven Filterteils . . . . .	121
5.15. Berechnung des nicht-rekursiven Filterteils . . . . .	122
5.16. Für die Mikrocontroller-Implementierung optimierte Filterstruktur des Berechnungsschritts N+1 (nach [64]) . . . . .	122
6.1. Neu entwickeltes Messsystem mit Batteriesteuergerät und Zellsensor . . . .	124
6.2. Batteriesterngerät mit aufgesteckten Erweiterungsmodulen . . . . .	126
6.3. Bestücktes CC1101 Transceiver-Erweiterungsmodul . . . . .	126
6.4. Bestücktes Strommess-Erweiterungsmodul . . . . .	127
6.5. Prinzipieller Messaufbau zum Test des Strommess-Erweiterungsmoduls . .	127
6.6. Erzeugte Spannung durch das Strommess-Erweiterungsmodul . . . . .	128
6.7. Oben: Vorderseite des bestückten Zellsensors mit Beschriftung einzelner Funktionsteile und Bauteile. Unten: Rückseite des Zellsensors mit den beiden JTAG-Interfaces . . . . .	129
6.8. Anpassungsnetzwerk der Schleifenantenne . . . . .	130
6.9. Simulierte $S_{11}$ -Parameter nach Anpassung der Schleifenantenne . . . . .	130
6.10. Gemessene Abstrahlleistung der Schleifenantenne . . . . .	131
6.11. Einfluss der Abschaltung des TPS61201 auf die analoge Vorverarbeitung . .	133
6.12. Steuerung der analogen Vorverarbeitung . . . . .	134
6.13. Ermittelte Laufzeiten der dynamischen Laufzeitermittlung mit 1.500 Messwerten: Mittelwert = $15,86 \mu s$ , $\sigma = 0,2832 \mu s$ . . . . .	135
6.14. Ermittelte Laufzeiten mittels Oszilloskop mit 1.500 Messwerten: Mittelwert = $16,16 \mu s$ , $\sigma = 0,2274 \mu s$ . . . . .	136
6.15. Messaufbau für die phasenrichtige Strom- und Spannungsaufnahme des Messsystems . . . . .	137
6.16. Überprüfung der phasenrichtigen Spannungsaufnahme des Zellsensors und des Batteriesteuergeräts . . . . .	137
6.17. Entwickelte Testimpedanz . . . . .	138
6.18. Schaltplan der entwickelten Testimpedanz . . . . .	139
6.19. Prinzipieller Messaufbau zur Vermessung der Testimpedanz . . . . .	140
6.20. Erste Impedanzmessung an der Testimpedanz mit einer Synchronisationszeit von $72,2 \mu s$ . . . . .	141
6.21. Zeiten für die synchrone Strom- und Spannungsmessung . . . . .	143
6.22. Gemessener Amplituden- und Phasengang der analogen Vorverarbeitung . .	144
6.23. Veranschaulichung der zeitlichen Verschiebung zwischen Messspannung und Strom . . . . .	145
6.24. Zusammensetzung der Zeiten für eine synchrone Strom- und Spannungsmessung . . . . .	145

---

6.25. Synchrones Impedanzspektrum der Testimpedanz mit einer Synchronisationszeit von $79,12\mu\text{s}$ . . . . .	146
6.26. Messaufbau für die Impedanzspektroskopie an einer $\text{LiFePO}_4$ -Zelle . . . . .	147
6.27. Vergleich einer Impedanzmessung zwischen einem Labormessgerät und einer Messung mittels des Zellsensors. Dabei wurden Frequenzen zwischen 100 MHz und 2 kHz gewählt . . . . .	148
6.28. Weiterer Vergleich einer Impedanzmessung zwischen einem Labormessgerät und einer Messung mittels des Zellsensors. Dabei wurden Frequenzen zwischen 100 MHz und 2 kHz gewählt . . . . .	149
6.29. Kalendarisch gemessene Alterung einer $\text{LiFePO}_4$ -Zelle . . . . .	150
6.30. 2. Alterungsmessung einer $\text{LiFePO}_4$ -Zelle am 29. Mai 2015 . . . . .	151
6.31. 3. Alterungsmessung einer $\text{LiFePO}_4$ -Zelle am 27. Juli 2015 . . . . .	152
6.32. Vergleich der gemessenen Impedanzspektren . . . . .	153
6.33. Impedanzmessung bei verschiedenen Ladezuständen mit dem FuelCon TrueData-EIS . . . . .	154
6.34. Impedanzmessung bei verschiedenen Ladezuständen mit dem entwickelten Messsystem . . . . .	155
6.35. Impedanzmessung bei verschiedenen Temperaturen: Gemessen mit FuelCon TrueData-EIS . . . . .	156
6.36. Impedanzmessung bei verschiedenen Temperaturen: Gemessen mit dem entwickelten Messsystem . . . . .	156
A.1. Montierte AD-Wandler Erweiterungsplatine auf einem Zellsensor . . . . .	178
A.2. Messung mit AD7691 AD-Wandler . . . . .	179
A.3. Weitere Messung mit AD7691 AD-Wandler . . . . .	180
B.1. Spannungsversorgungs-Erweiterungsmodul . . . . .	181
B.2. Zellsensor mit montiertem Spannungsversorgungs-Erweiterungsmodul . . . . .	182
B.3. Abschaltung des TPS61202 . . . . .	182
C.1. Platinen-Struktur in CST Microwave Studio . . . . .	185
C.2. Platinen-Struktur mit Oberflächenströmen bei 434 MHz . . . . .	186
C.3. 2D-Abstrahlcharakteristik bei 434 MHz . . . . .	186
C.4. Platinen-Struktur mit Oberflächenströmen bei 509,5 MHz . . . . .	187
C.5. 2D-Abstrahlcharakteristik bei 509,5 MHz . . . . .	187
C.6. Platinen-Struktur mit eingebrachten Induktivitäten . . . . .	188
C.7. Überarbeitete Platinen-Struktur mit Oberflächenströmen bei 434 MHz . . . . .	189
C.8. Korrigiertes 2D-Abstrahlcharakteristik bei 434 MHz . . . . .	189
C.9. 3D-Abstrahlcharakteristik bei 434 MHz mit eingesetzten Induktivitäten . . . . .	190
C.10. Richtdiagramm der Schleifenantenne mit eingesetzten Induktivitäten in der Theta-Ebene . . . . .	190
C.11. Streuparameter der Schleifenantenne / CST Microwave Studio . . . . .	191

---

C.12. Errechnetes LC-Anpassungsnetzwerk zwischen Schleifenantenne und Antennenumschalter . . . . .	191
C.13. Optimierte Streuparameter der Schleifenantenne mit LC-Anpassungsnetzwerk/ AWR Design Environment . . . . .	192
C.14. Streuparametervergleich der simulierten und berechneten $S_{11}$ Streuparameter	192
C.15. Aufgeschraubter Zellsensor auf $\text{LiFePO}_4$ -Zelle . . . . .	193
C.16. Querschnitt des aufgeschraubten Zellsensors . . . . .	193
C.17. 2D-Abstrahlcharakteristik des aufgeschraubten Zellsensors . . . . .	194
C.18. 3D-Abstrahlcharakteristik des aufgeschraubten Zellsensors . . . . .	194
C.19. Zellsensor mit aufgetragener Epoxidharz-Schicht . . . . .	195
C.20. 2D-Abstrahlcharakteristik des Zellsensors mit Epoxidharz-Schicht . . . . .	195
C.21. Vergleich zwischen vergossenem und unvergossenem Zellsensor . . . . .	196
D.1. Aufbau zur künstlichen Batteriezellen-Alterung . . . . .	197
D.2. Künstliche Alterung einer $\text{LiFePO}_4$ -Zelle . . . . .	198
E.1. Ladungsabhängige Impedanzmessungen mit FuelCon TrueData-EIS . . . . .	199
E.2. Ladungsabhängige Impedanzmessungen mit Zellsensoren und Batteriesteu- ergerät . . . . .	200
E.3. Impedanzmessungen an ECC-LFPP 45 Ah Zelle 1 . . . . .	201
E.4. Impedanzmessungen an ECC-LFPP 45 Ah Zelle 2 . . . . .	202
G.1. Befestigungsadapter . . . . .	207
G.2. Montierter und vergossener Zellsensor auf einer ECC-LFPP 45Ah $\text{LiFePO}_4$ -Zelle . . . . .	207
H.1. PC lauffähiges Goertzel-Testprogramm . . . . .	210

# Literaturverzeichnis

- [1] A123. *Nanophosphate® High Power Lithium Ion Cell ANR26650M1-B*. A123 Systems, n.a. 2012. <http://www.a123systems.com/lithium-ion-cells-26650-cylindrical-cell.htm>; abgerufen am 17. Juni 2015.
- [2] Alexander Angold. *Verfahren zur aufwandsreduzierten Elektrochemischen Impedanzspektroskopie für Starterbatterien*. HAW Hamburg, März 2014. Bachelorthesis.
- [3] Kevin Banks. *The Goertzel Algorithm*. Embedded Systems Programming, September 2002. <http://www.embedded.com/design/configurable-systems/4024443/The-Goertzel-Algorithm>; abgerufen am 05. März 2015.
- [4] Evgenij Barsoukov and J. Ross Macdonald, editors. *Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications*. Wiley-Interscience, 2 edition, 3 2005.
- [5] Marcel Baunach. *Advanced Timestamping for pairwise Clock Drift Detection in Wireless Sensor - Actuator Networks*. Universitaet Potsdam, 13. GI/ITG KuVS Fachgespräch Sensornetze, Graz University of Technology / Austria / Institute for Technical Informatics, September 2014.
- [6] Deutsche Bundesregierung. *Mobilität der Zukunft sauber und kostengünstig*. 2015. [http://http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/Mobilitaet/mobilitaet\\_zukunft/\\_node.html](http://http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/Mobilitaet/mobilitaet_zukunft/_node.html); abgerufen am 03. August 2015.
- [7] Naim Dahnoun. *Goertzel Code*. Bristol University / Texas Instruments, 2004. <http://www.ti.com/ww/cn/uprogram/share/ppt/c6000/Chapter17.ppt>; abgerufen am 05. März 2015.
- [8] Analog Devices. *AD7641 Rev. 0*. Analog Devices, Inc, 2006. [http://www.analog.com/static/imported-files/data\\_sheets/AD7641.pdf](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7641.pdf); abgerufen am 14. Februar 2015.
- [9] Analog Devices. *AD7767 Rev. C*. Analog Devices, Inc, 2010. [http://www.analog.com/static/imported-files/data\\_sheets/AD7767.pdf](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7767.pdf); abgerufen am 14. Februar 2015.

- [10] Analog Devices. *AD7176-2 Rev. B*. Analog Devices, Inc, 2014. [http://www.analog.com/static/imported-files/data\\_sheets/AD7176-2.pdf](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7176-2.pdf); abgerufen am 14. Februar 2015.
- [11] Analog Devices. *AD7690 Rev. C*. Analog Devices, Inc, 2014. [http://www.analog.com/static/imported-files/data\\_sheets/AD7690.pdf](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7690.pdf); abgerufen am 14. Februar 2015.
- [12] Analog Devices. *AD7691 Rev. D*. Analog Devices, Inc, 2014. [http://www.analog.com/static/imported-files/data\\_sheets/AD7691.pdf](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7691.pdf); abgerufen am 14. Februar 2015.
- [13] Analog Devices. *AD7989 Rev. A*. Analog Devices, Inc, 2014. [http://www.analog.com/static/imported-files/data\\_sheets/AD7989-1\\_7989-5.pdf](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7989-1_7989-5.pdf); abgerufen am 14. Februar 2015.
- [14] Phillip Durdaut. *Zellensensor für Fahrzeugbatterien mit Kommunikation und Wakeup-Funktion im ISM-Band bei 434MHz*. HAW Hamburg, Bachelorthesis, Feb. 2013.
- [15] Nationale Plattform Elektromobilität. *Fortschrittsbericht 2014 Bilanz der Marktvorbereitung*. n.a. 2014. [http://http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten\\_BMU/Download\\_PDF/Verkehr/emob\\_fortschrittsbericht\\_2014\\_bf.pdf](http://http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Verkehr/emob_fortschrittsbericht_2014_bf.pdf); abgerufen am 03. August 2015.
- [16] Jan Kießling und Xiaobo Liu-Henke Florian Quantmeyer. *Modellbildung und Identifikation der Energiespeicher für Elektrofahrzeuge*. Ostfalia Hochschule fuer angewandte Wissenschaften, n.a.
- [17] Alex Friesen. *Influence of different aging mechanisms on the abuse behavior of commercial lithium-ion18650 type cells*. Kraftwerk Batterie 2015, Meet Battery Research Center, University of Münster, 2015.
- [18] Heinrich Frohne, Karl-Heinz Löcherer, Hans Müller, Thomas Harriehausen, and Dieter Schwarzenau. *Moeller Grundlagen der Elektrotechnik*. Vieweg+Teubner Verlag, 21 edition, 2008.
- [19] Ludwig J. Gauckler. *Electrochemical impedance spectroscopy*. ETH Zuerich, 2003. <http://www.nonmet.mat.ethz.ch/education/courses/ceramic2/EIS.ppt>; abgerufen am 24. September 2014.
- [20] ECC Batteries GmbH. *Technische Daten ECC Batteries GmbH*. ECC Batteries GmbH, n.a. [www.eccbatteries.com/files/kunden-\\_technische\\_daten\\_ecc\\_batteries\\_gmbh.pdf](http://www.eccbatteries.com/files/kunden-_technische_daten_ecc_batteries_gmbh.pdf); abgerufen am 24. Juni 2015.
- [21] Gerald Goertzel. *An Algorithm for the Evaluation of Finite Trigonometric Series*. Mathematical Association of America, The American Mathematical Monthly, Vol. 65, No. 1 (Jan., 1958), pp. 34-35, Januar 1958.

- [22] José A. Gutierrez. *IEEE Std. 802.15.4. Enabling Pervasive Wireless Sensor Networks*. Berkeley University of California, Graduate Seminar on Sensor Actuator Networks, n.a. 2005. [www.cs.berkeley.edu/~prabal/teaching/cs294-11-f05/slides/day21.pdf](http://www.cs.berkeley.edu/~prabal/teaching/cs294-11-f05/slides/day21.pdf); abgerufen am 08. Juni 2015.
- [23] Michael Haag. *Difference Equation*. OpenStax-CNX, Dezember 2013. [http://cnx.org/contents/31c2d232-06c2-4aaa-a6cf-499378420b09@7/Difference\\_Equation](http://cnx.org/contents/31c2d232-06c2-4aaa-a6cf-499378420b09@7/Difference_Equation); abgerufen am 26. März 2015.
- [24] Carl H. Hamann and Wolf Vielstich. *Elektrochemie*. Wiley-VCH, 1 edition, Juni 1997.
- [25] J. Vetter P. Novak M.R. Wagner C. Veitb K.-C. Möller J.O. Besenhard M. Winter M. Wohlfahrt-Mehrens C. Vogler A. Hammouch. *Ageing mechanisms in lithium-ion batteries*. Journal of Power Sources 147 (2005) 269?281, March 2005.
- [26] Frieder Herb. *Alterungsmechanismen in Lithium-Ionen-Batterien und PEM-Brennstoffzellen und deren Einfluss auf die Eigenschaften von daraus bestehenden Hybrid-Systemen*. Universität Ulm, 5 2010.
- [27] Arthur R. Von Hippel and Alexander S. Labounsky, editors. *Dielectric Materials and Applications*. Artech House Inc, 12 1995.
- [28] S.M.M. Alavi C.R. Birkl D.A. Howey. *Time-domain fitting of battery electrochemical impedance models*. Journal of Power Sources 288 (2015) 345?352, August 2015.
- [29] F. Huet. *A review of impedance measurements for determination of the state-of-charge or state-of-health of secondary batteries*. Journal of Power Sources 70 (1998) 59-69, Physique des Liquides et Electrochimie, Universitd Pierre et Marie Curie, Paris, 19. May 1997.
- [30] Texas Instruments. *24-Bit, Wide Bandwidth Analog-to-Digital Converter, Rev. F*. Texas Instruments, Oktober 2007. <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1271.pdf>; abgerufen am 14. Februar 2015.
- [31] Texas Instruments. *Low-Power,2-Channel,24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements, Rev. B*. Texas Instruments, September 2012. <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1291.pdf>; abgerufen am 14. Februar 2015.
- [32] Texas Instruments. *MSP430 SoC With RF Core, Rev. H*. Texas Instruments, September 2012. <http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=cc430f5137&fileType=pdf>; abgerufen am 24. März 2015.
- [33] Texas Instruments. *MSPMATHLIB: An Optimized MSP430 Library of Floating-Point Scalar Math Functions*. Texas Instruments, Mai 2013. <http://www.ti.com/lit/ug/slau499/slau499.pdf>; abgerufen am 21. Juli 2015.



- [34] Texas Instruments. *TivaWare Peripheral Driver Library, Rev. 2.1.1.71*. Texas Instruments, Mai 2015. <http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=spmu298&fileType=pdf>; abgerufen am 21. Juli 2015.
- [35] Texas Instruments. *TLV700 200-mA Low-IQ Low-Dropout Regulator for Portable Devices*. Texas Instruments, April 2015. <http://www.ti.com/lit/ds/slvsa00e/slvsa00e.pdf>; abgerufen am 04. August 2015.
- [36] Texas Instruments. *ARM Cortex-M4F based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad*. n.a. 2015. <http://www.ti.com/tool/ek-TM4C1294xl>; abgerufen am 03. August 2015.
- [37] Maxim Integrated. *MAX11200/MAX11210, Rev. 2*. Maxim Integrated, Dezember 2012. <http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX11200-MAX11210.pdf>; abgerufen am 26. Juni 2015.
- [38] Suyash Jain. *Layout Review Techniques for Low Power RF Designs - SWRA367A*. Texas Instruments, August 2012. <http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swra367&fileType=pdf>; abgerufen am 14. Juli 2015.
- [39] Don H. Johnson. *Scanning Our Past - Origins of the Equivalent Circuit Concept: The Voltage-Source Equivalent*. IEEE, 2003.
- [40] Douglas L. Jones. *Goertzel's Algorithm*. OpenStax-CNX, September 2006. [http://cnx.org/contents/930e1c73-03a8-49ba-9c1d-c4e959944572@5/Goertzel%27s\\_Algorithm](http://cnx.org/contents/930e1c73-03a8-49ba-9c1d-c4e959944572@5/Goertzel%27s_Algorithm); abgerufen am 26. März 2015.
- [41] Klaus W. Kark. *Antennen und Strahlungsfelder: Elektromagnetische Wellen auf Leitungen, im Freiraum und ihre Abstrahlung*. Springer Vieweg, 5., überarb. u. erw. Aufl. 2014 edition, 4 2014.
- [42] Martin Kiel. *Impedanzspektroskopie an Batterien unter besonderer Berücksichtigung von Batteriesensoren für den Feldeinsatz*. Shaker, 1., Aufl. edition, 6 2013.
- [43] Microstar Laboratories. *Quick Development of the Goertzel Filter*. Microstar Laboratories, 2009. <http://www.mstarlabs.com/dsp/goertzel/goertzel.html>; abgerufen am 26. März 2015.
- [44] Douglas Lyon. *The Discrete Fourier Transform Part 2: Radix 2 FFT*. ETH Zuerich, July 2009. [http://www.jot.fm/issues/issue\\_2009\\_07/column2.pdf](http://www.jot.fm/issues/issue_2009_07/column2.pdf); abgerufen am 29. März 2015.
- [45] Robert Kostecki Marie Kerlau. *Interfacial Impedance Study of Li-Ion Composite Cathodes during Aging at Elevated Temperatures*. Journal of The Electrochemical Society, nr. 9, s. 1644 - 1648 edition, Vol. 153 (2006).

- [46] Marian Mazurek. *Impedanzspektroskopie an Anodenkatalysatoren für Membranbrennstoffzellen*. Universität Darmstadt, 2006. <http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/694/>; abgerufen am 08. April 2015.
- [47] Eberhard Meissner and Gerolf Richter. *Battery Monitoring and Electrical Energy Management Precondition for future vehicle electric power systems*. Journal of Power Sources 116 (2003) 79-98, 2003.
- [48] Eike Mense. *Hard- und Softwareentwicklung für einen drahtlosen Batterie-Zellen-Sensor zur elektrochemischen Impedanzspektroskopie*. HAW Hamburg, November 2014. Masterthesis.
- [49] Allegro MicroSystems. *ACS716*. Allegro MicroSystems, 2013. <http://www.allegromicro.com/~media/Files/Datasheets/ACS716-Datasheet.ashx?la=en>; abgerufen am 06. August 2015.
- [50] Otto Mildenerger. *Übertragungstechnik: Grundlagen analog und digital (Studium Technik)*. Vieweg Verlagsgesellschaft, 1997 edition, 9 1997.
- [51] Marta Baginska Benjamin J. Blaiszik Ryan J. Merriman Nancy R. Sottos Jeffrey S. Moore and Scott R. White. *Autonomic Shutdown of Lithium-Ion Batteries Using Thermoresponsive Microspheres*. Adv. Energy Mater., November 2011.
- [52] Miguel Morales and Dung Dang. *CC430 RF Examples, Rev. C*. Texas Instruments, September 2013. <http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slaa465c&fileType=pdf>; abgerufen am 13. März 2015.
- [53] Jens-Rainer Ohm and Hans Dieter Lüke. *Signalübertragung*. Springer, 6., neubearb. u. erw. aufl. edition, 5 1995.
- [54] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schaffer. *Zeitdiskrete Signalverarbeitung*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, durchgesehene auflage edition, 12 1998.
- [55] Panasonic. *Datasheet: Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitor, Radial Lead Type FC A*. Panasonic.
- [56] Lothar Papula. *Mathematische Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler*. Vieweg, 8. auflage edition, 2003.
- [57] Andreas Jossen Peter Keil. *Aufbau und Parametrierung von Batteriemodellen*. Technische Universität München, Lehrstuhl für Elektrische Energiespeichertechnik Technische Universität München, Arcisstr. 21, 80333 München, n.a. <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1162416/1162416.pdf>; abgerufen am 23. März 2015.
- [58] J. E. B. Randles. *Kinetics of Rapid Electrode Reactions*. University of Birmingham, Department of Chemistry, University of Birmingham, 5. March 1947.

- [59] Brian Redding. *Bluetooth Technology - Advanced*. Bluetooth World 2013, 2013.
- [60] Michael Roscher. *Zustandserkennung von LiFePO<sub>4</sub>-Batterien für Hybrid- und Elektrofahrzeuge*. Shaker, 1., aufl. edition, 2 2011.
- [61] Joachim Georg Roth. *Impedanzspektroskopie als Verfahren zur Alterungsanalyse von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen*. Dr. Hut, 6 2013.
- [62] Nico Sassano. *Hard- und Softwareentwicklung für einen drahtlos kommunizierenden Batterie-Zellensensor mit funksynchronisierter Messung*. HAW Hamburg, August 2013. Bachelorthesis.
- [63] Matthias Schöllmann. *Energiemanagement und Bordnetze - moderne Bordnetzarchitekturen und innovative Lösungen für Energiemanagementsysteme in Kraftfahrzeugen*. Expert-Verlag, Renningen, 1. aufl. edition, 2005.
- [64] A. Tchegho. *Optimal High-Resolution Spectral Analyzer*. Technische Universität München, 2008. [http://www.date-conference.com/proceedings1/papers/2008/date08/pdf/files/01.5\\_1.pdf](http://www.date-conference.com/proceedings1/papers/2008/date08/pdf/files/01.5_1.pdf); abgerufen am 22. Juli 2015.
- [65] Linear Technology. *LTC2376-20 Rev. A*. Linear Technology, 2014. <http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/237620f.pdf>; abgerufen am 14. Februar 2015.
- [66] Dietmar Thate. *Energie aus der Kaffeepackung*. Opel AG, 7 2011. <http://www.opel-blog.com/2011/07/01/energie-aus-der-kaffeepackung/>; abgerufen am 02. Juli 2015.
- [67] Ulrich Tietze, Christoph Schenk, and Eberhard Gamm. *Halbleiter-Schaltungstechnik*. Springer, 14., überarb. und erw. aufl. 2012 edition, 11 2012.
- [68] Wolfgang Weydanz u. Andreas Jossen. *Moderne Akkumulatoren richtig einsetzen*. Reichardt Verlag, 1 edition, Januar 2006.
- [69] Callaway E. Gorday P. Hester L. Gutierrez J.A. Naeve M. Heile B. Bahl V. *Home Networking with IEEE 802.15.4: A Developing Standard for Low-Rate Wireless Personal Area Networks*. Communications Magazine, IEEE (Volume:40 , Issue: 8 ), 8 2002.
- [70] Karl-Ragmar Riemschneider Valentin Roscher, Nico Sassano. *Synchronisation using Wireless Trigger-Broadcast for Impedance Spectroscopy of Battery Cells*. IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), Zadar, Croatia, 04 2015.
- [71] Norbert Wagner. *Einsatz der Impedanzspektroskopie in der Brennstoffzellenforschung*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011. <http://elib.dlr.de/71382/1/tm0073.pdf>; abgerufen am 28. Februar 2015.

- 
- [72] Henning Wallentowitz and Konrad Reif. *Handbuch Kraftfahrzeugelektronik: Grundlagen - Komponenten - Systeme - Anwendungen (ATZ/MTZ-Fachbuch)*. Vieweg+Teubner Verlag, 2006 edition, 9 2006.
- [73] Martin Werner. *Digitale Signalverarbeitung mit MATLAB*. Vieweg+Teubner Verlag, 3., vollst. überarb. u. akt. aufl. 2006 edition, 4 2006.

# Abkürzungsverzeichnis

<b>AD</b>	Analog-Digital
<b>BS</b>	Batteriesteuergerät
<b>DFT</b>	diskreten Fourier Transformation
<b>DoD</b>	Depth of Discharge
<b>EIS</b>	elektrochemische Impedanzspektroskopie
<b>ENOB</b>	Effective Number of Bits
<b>EoL</b>	End of Life
<b>ESR</b>	Equivalent Series Resistance
<b>FFT</b>	Fast Fourier-Transformation
<b>HAW</b>	Hochschule für Angewandte Wissenschaften
<b>HF</b>	Hochfrequenz
<b>IC</b>	Integrated Circuit
<b>ISR</b>	Interrupt Service Routine
<b>LiFePO</b>	Lithium-Eisenphosphat
<b>OCV</b>	Open Circuit Voltage
<b>OOK</b>	On-Off-Keying
<b>PCB</b>	Printed Circuit Board
<b>RF</b>	Radio frequency
<b>SAR</b>	Sukzessives Approximation Register
<b>SNR</b>	Signal-Rausch-Abstand
<b>SoC</b>	State of Charge
<b>SoH</b>	State of Health
<b>ZS</b>	Zellsensor

# A. Hochauflösende AD-Wandler Erweiterung Platine

In diesem Abschnitt, wird die fertig montierte hochauflösende AD-Wandler Erweiterung Platine vorgestellt und die mit diesem AD-Wandler erzielten Messungen aufgezeigt.

In Abbildung A.1 ist die montierte Erweiterung Platine auf dem Zellsensor zu sehen. Diese Erweiterung Platine lässt sich über eine einfache Steckverbindung auf der Unterseite mit den Zellsensor verbinden. Zur mechanischen Befestigung kann die Platine durch zwei Schrauben mit dem Zellsensor verbunden werden. Die einzelnen Komponenten der Schaltung sind hier farblich hervorgehoben. Zudem sind auf der Platine noch einige Ausgänge des Mikrocontrollers vorhanden, die als Debug Möglichkeiten genutzt werden können. Die genaue Belegung der Ausgänge ist aus dem Schaltplan in Anhang J zu entnehmen.

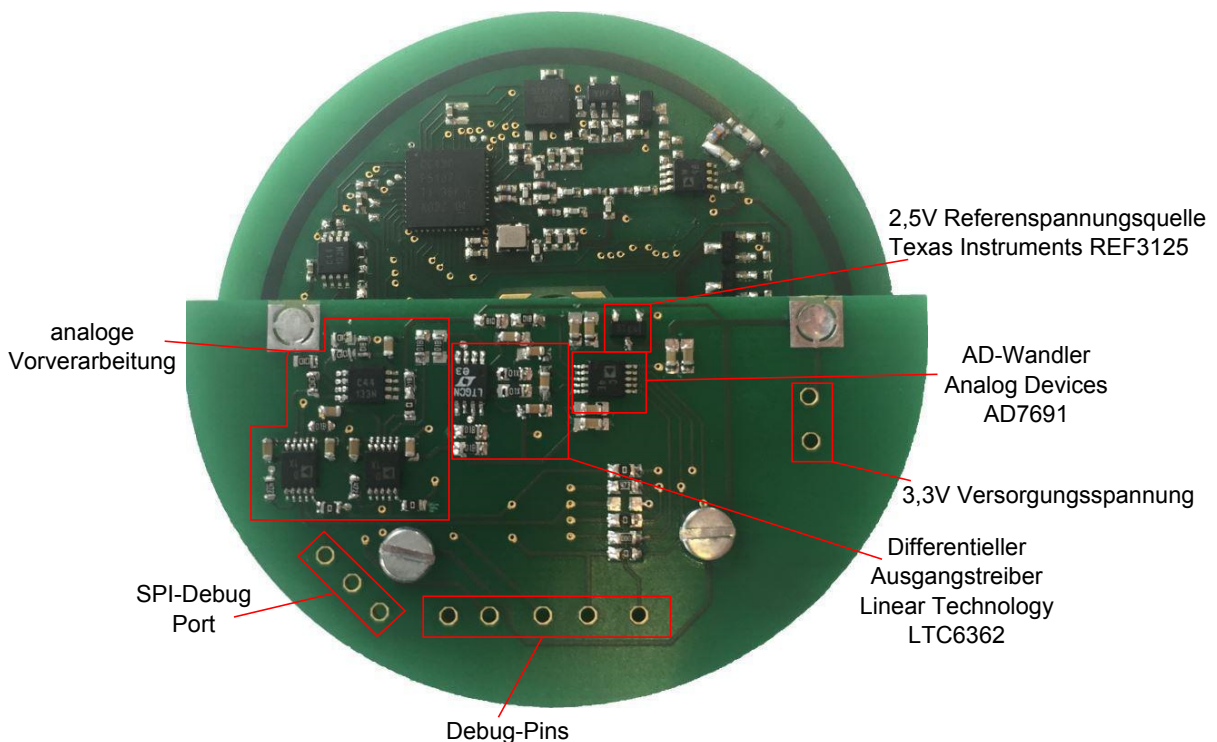


Abbildung A.1.: Montierte AD-Wandler Erweiterung Platine auf einem Zellsensor

Bei der Inbetriebnahme der Erweiterung Platine wurde festgestellt, dass ein Schaltungsfehler auf der Platine vorhanden ist. Dieser Fehler verhindert, dass der AD-Wandler

einen Interrupt an den Mikrocontroller ausgeben kann. Ursache hierfür war, dass der SPI-Dateneingang (SDI) am AD-Wandler mit dem SPI-Datenausgang (MOSI) des Mikrocontrollers verbunden war. Dieser muss aber mit der 3,3 V Versorgungsspannung verbunden sein, damit der Interrupt Betrieb möglich ist [12]. Dieser Fehler konnte aber leicht durch eine Lötbrücke behoben werden und wurde im Schaltplan und im Layout, die sich im Anhang J und K befinden, bereits ausgebessert.

Ausführliche Untersuchungen konnten mit dieser Erweiterungsplatine aus Zeitgründen nicht gemacht werden. Dennoch konnten in den Voruntersuchungen einige Messungen mit dieser Schaltung durchgeführt werden, dessen Ergebnisse hier kurz vorgestellt werden. Da die genaue Synchronisation zwischen den Strom- und Spannungswerten zu diesem Zeitpunkt noch in Bearbeitung war, wurde die Strommessung von einem zweiten Zellsensor durchgeführt. Dadurch konnte von einer synchronen Messung zwischen Strom- und Spannungswerten ausgegangen werden.

Im Folgenden werden zwei verschiedene Messungen gezeigt, die durch den hochauflösenden AD-Wandler gemessen werden konnten.

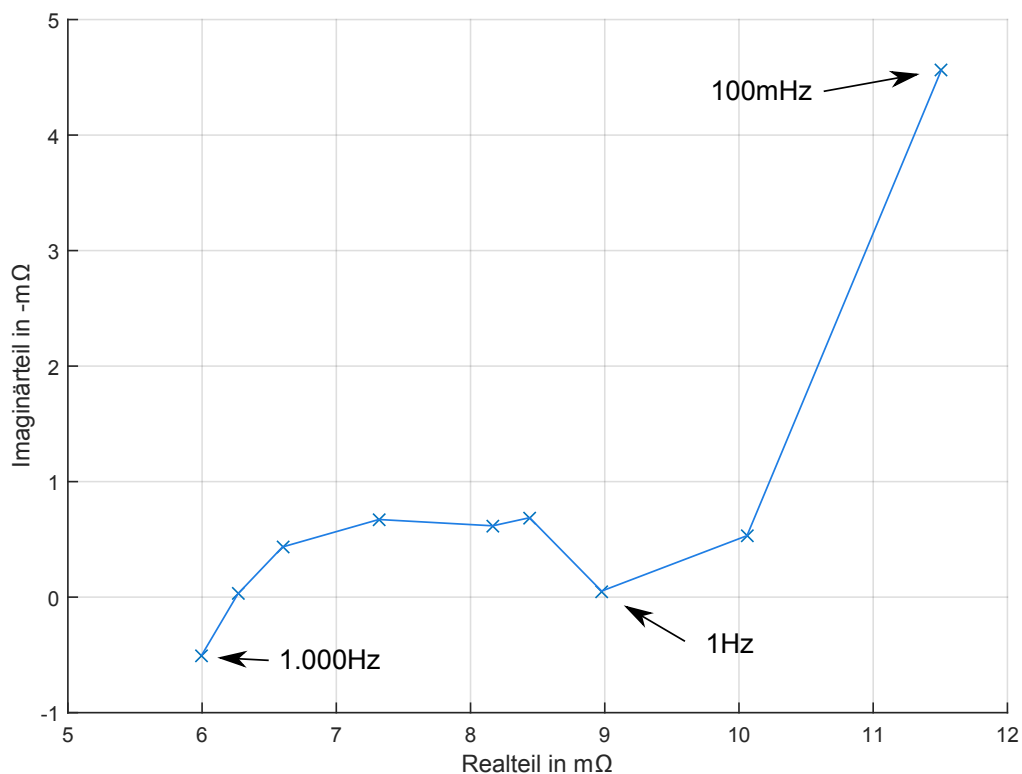


Abbildung A.2.: Messung mit AD7691 AD-Wandler

Die Abbildung A.2 zeigt die aufgenommenen Impedanzkurve. Diese zeigt den typischen Verlauf, der erwartet wurde. Gemessen wurde dieses Impedanzspektrum bei normaler Zimmertemperatur von ca. 20°C. Der Ladezustand der Zelle wurde bei dieser Messung nicht beachtet. Nach der Auswertung der Messungen in Abschnitt 6.3.3 kann aber von einer entladenen Zelle ausgegangen werden.

Die folgende Messung in Abbildung A.3 zeigt ebenfalls eine Messung, die mit dem hochauflösenden AD-Wandler gemessen werden konnte.

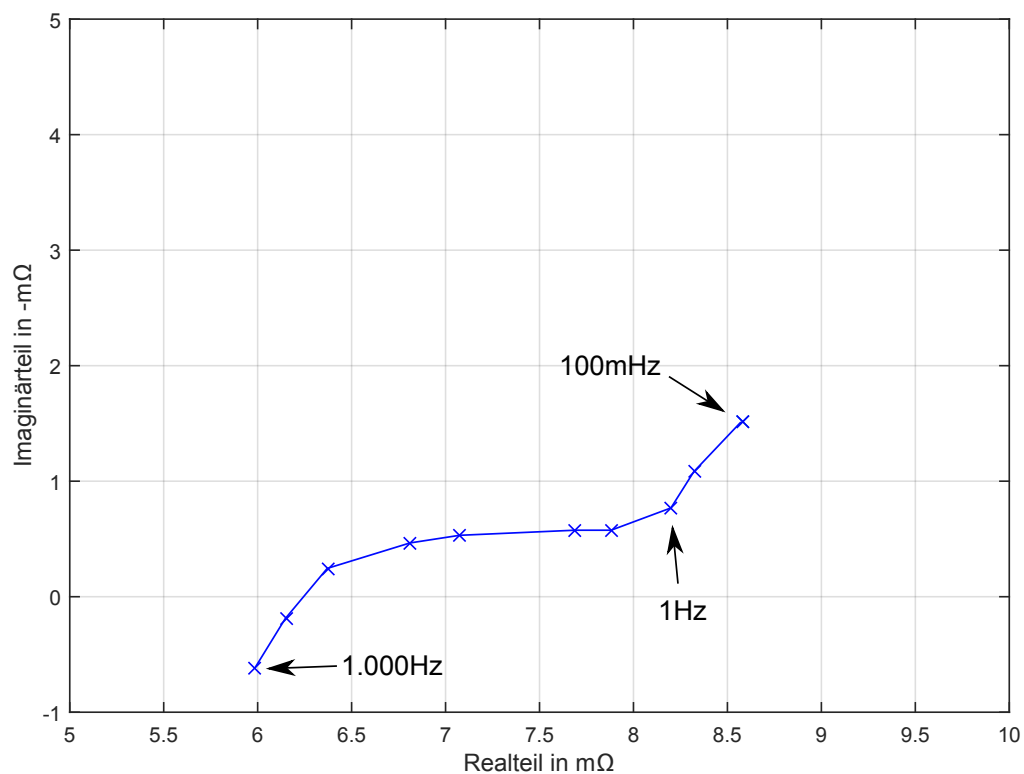


Abbildung A.3.: Weitere Messung mit AD7691 AD-Wandler

Zu beiden Messungen sind keine Vergleichswerte mit dem FuelCon TrueData-EIS vorhanden. Dennoch kann gesagt werden, dass die Messung mit dem hochauflösenden AD-Wandler ebenfalls sehr gute quantitative Messwerte liefert. Allerdings ist bei beiden Messungen zu beobachten, dass beide Impedanzkurven im Vergleich zu den Messungen mit dem internen AD-Wandler des Mikrocontrollers einen geringeren Imaginärteil aufweisen. Ob dies an einem Messfehler liegt oder durch auftretende Induktivitäten in der Schaltung oder des Messaufbaus liegt kann an dieser Stelle nicht gesagt werden. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig, die in dieser Arbeit nicht durchgeführt werden.



## B. Spannungsversorgungs- Erweiterungsmodul

Ein möglicher Lösungsansatz zur Stabilisierung der Spannungsversorgung wird im Folgenden vorgestellt. Dabei sollen die Spannungseinbrüche, die in Abschnitt 6.1.2 gezeigt wurden, verhindert werden und somit ein ungestörter Betrieb der analogen Vorverarbeitung gewährleistet werden. Die Idee ist dabei ein höheres Spannungspotenzial auf den Zellsensor zu bringen, damit die Spannungseinbrüche bei einer Abschaltung nicht mehr in den Bereich der 3,3 V Spannungsversorgung fallen.

Dabei wird die Spannung zunächst durch einen Step-Up-Converter TPS61202 auf das Potenzial von 5,0 V gebracht. Da die Spannungsversorgung des Zellsensors aber niedriger ist, wird diese durch den LDO TLV70033DDCT von Texas Instruments wieder auf die benötigten 3,3 V gebracht.

Dieser besitzt einen geringen Dropout von 43 mV [35], wodurch ein Spannungsabfall von bis zu 1,657 V möglich ist, bevor die 3,3 V beeinflusst werden.

$$5,0 \text{ V} - 3,3 \text{ V} - 43 \text{ mV} = 1,657 \text{ V} \quad (\text{B.1})$$

Diese Idee wurde auf einer Erweiterungsplatine realisiert, die einfach durch den schon vorhandenen Erweiterungsstecker mit dem Zellsensor verbunden wird. Lediglich der positive Zellanschluss muss mit der Zellsensorplatine und der Zelle verbunden werden. Abbildung B.1 zeigt das bestückte Erweiterungsmodul.

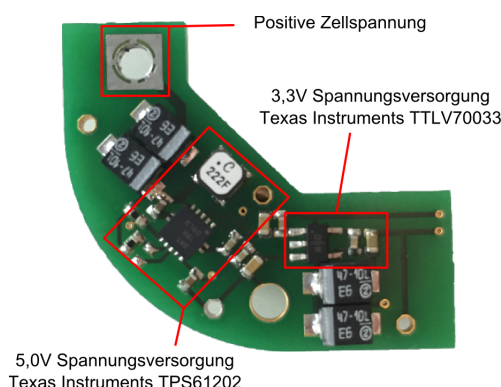


Abbildung B.1.: Spannungsversorgungs-Erweiterungsmodul

In Abbildung B.2 ist das montierte Erweiterungsmodul auf dem Zellsensor zu sehen.

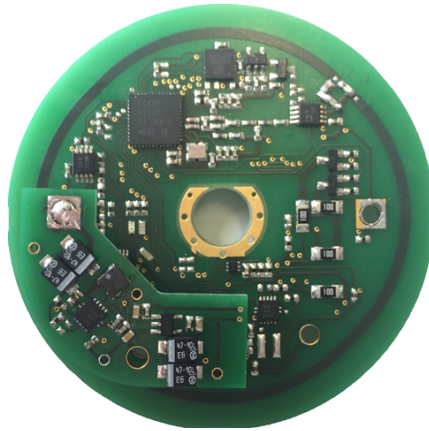


Abbildung B.2.: Zellsensor mit montiertem Spannungsversorgungs-Erweiterungsmodul

Erste Messungen mit den Erweiterungsmodul zeigten, dass durch diese Maßnahme die Beeinflussung der analogen Vorverarbeitung verhindert werden kann. Es konnten Messungen bis zu 6 kHz durchgeführt werden, bevor es wieder zu Störungen in der Zellversorgungsspannung kommt. Dies kommt daher, dass der TPS61202 ab einer bestimmten Messfrequenz bzw. Abschalt rate nicht mehr schafft, die 5,0 V stabil zu halten, wodurch es zu einem langsamen Absinken der Spannung kommt.

Es wurde aber auch festgestellt, dass nach den Ab- und Anschalten des TPS61202 eine Mindestzeit von ca.  $480\mu\text{s}$  vergehen muss, bevor eine neue Messung gestartet werden kann. Dies ist in Abbildung B.3 zu sehen.

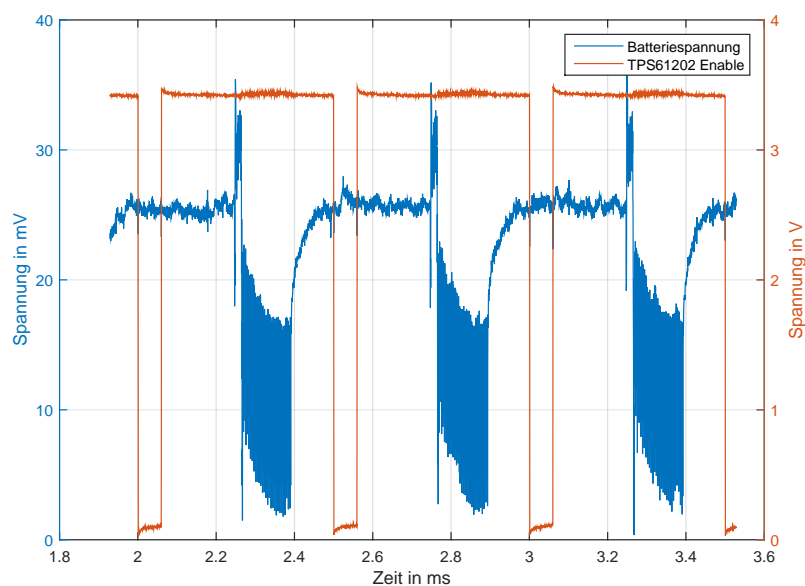


Abbildung B.3.: Abschaltung des TPS61202

In Abbildung B.3 sind die bekannten Störungen auf die Batteriespannung zu sehen. Neben den Störungen, sind auch die Bereiche der Abschaltung des TPS61202 zu sehen. Nach jeder Anschaltung (steigende Flanke in der Abbildung) des TPS61202 tauchen Störungen auf der Batteriespannung auf, die erst nach einer Zeit von ungefähr  $480\mu\text{s}$  wieder verschwinden. Dies beschränkt die mögliche Messrate auf etwas über 2 kHz.

$$f_{\text{max.}} = \frac{1}{480\mu\text{s}} = 2083,3\text{ Hz} \quad (\text{B.2})$$

Ein schnellere Messrate ist zwar technisch möglich, aber es besteht aber die Gefahr, dass dadurch die Störungen mitgemessen werden.

Ob dieses Problem durch Schaltungsänderungen gelöst werden kann, muss in anderen Arbeiten untersucht werden. Ebenso kann untersucht werden, wie sich die Störungen auf die Messwerte auswirken.

## C. Simulation der Schleifenantenne

Dieses Kapitel soll einen Einblick in die Simulation des Zellsensors hinsichtlich seiner Abstrahlcharakteristik geben. Simuliert wird dabei mit dem 3D-FEM Simulationsprogramm CST Microwave Studio. Dieses erlaubt, komplette Platinenstrukturen auf ihre Abstrahlcharakteristik hin zu simulieren und zu untersuchen. Ziel dieser Simulation soll es sein, das Layout zu optimieren und die Abstrahlung der Schleifenantenne zu verbessern. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf lange Leitungsführungen gelegt werden. Diese können bei bestimmten Längen als parasitäre Antenne wirken und die Abstrahlcharakteristik beeinflussen. Ein Problem der parasitären Antennen ist, dass sie in Resonanz geraten können und einen Teil der aufgenommenen Leistung phasenverschoben wieder abstrahlen. Dadurch kann eine Richtwirkung der Antenne entstehen, sodass die Abstrahlcharakteristik in eine Richtung gebündelt wird [41].

Gerade Leitungslängen im Bereich von  $\lambda/2$  bis etwa  $\lambda/8$  können dabei als Strahlungsdirektor oder Reflektor auftreten. Diese liegen bei 434 MHz im Bereich von wenigen Zentimetern. Also genau in dem Längenbereich, die viele Signalleitungen auf dem Zellsensor haben.

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{300 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{434 \cdot 10^6 \text{ Hz}} \cdot \frac{1}{\sqrt{4,5}} = 32,99 \text{ cm} \quad (\text{C.1})$$

Mithilfe dieser Simulation sollen diese Leitungsstücke identifiziert und verbessert werden, damit eine optimale Abstrahlung des Zellsensors gewährleistet wird.

## Simulation des Sensorlayouts

Um das Layout des Zellsensors zu simulieren, wurde die gesamte Struktur in CST Microwave Studio geladen. Dabei wurden die obere und untere Kupferfläche mit einer Stärke von  $35\mu\text{m}$  eingefügt. Die Durchkontaktierungen (VIA), welche die Oberseite der Platine mit der Unterseite elektrisch verbinden, wurden als massiver Kupferzylinder eingefügt, um die Struktur hinsichtlich ihrer Komplexität nicht weiter zu belasten. An der realen Platine sind diese Durchkontaktierungen zylindrisch aufgebaut. Abbildung C.1 zeigt die importierte Platinenstruktur.

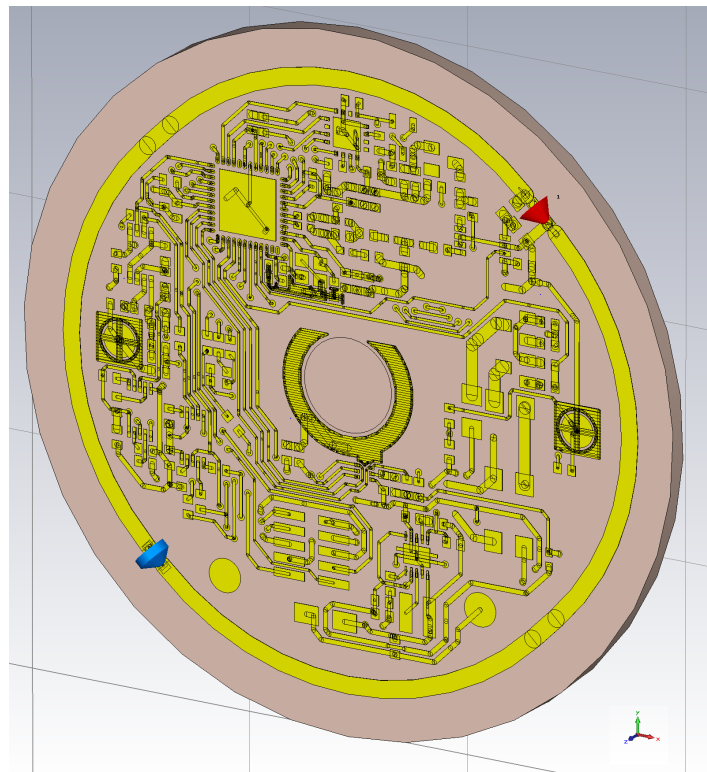


Abbildung C.1.: Platinen-Struktur in CST Microwave Studio

Als Platinenmaterial wurde das aus der Materialbibliothek bereitgestellte FR4 verwendet und mit einer Stärke von 1,6 mm definiert. Es werden somit alle Geometrien für die Simulation verwendet, wie sie der reale Zellsensor besitzt.

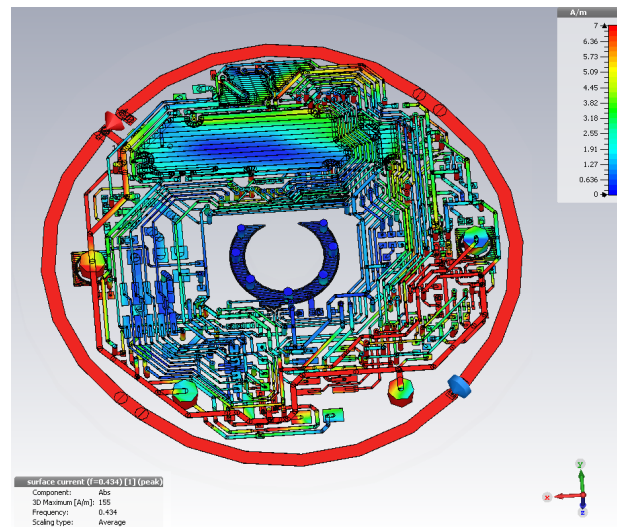


Abbildung C.2.: Platinen-Struktur mit Oberflächenströmen bei 434 MHz

In Abbildung C.2 ist der simulierte Zellsensor mit dessen Oberflächenströmen bei 434 MHz zu sehen. Zu erkennen ist, dass die äußere Schleifenantenne, wie gewünscht nach allen Seiten, eine hohe magnetische Feldstärke aufweist. Die inneren Leiterbahnen zeigen an manchen Stellen ebenfalls eine hohe magnetische Feldstärke. Dies zeigt, dass die inneren Strukturen ebenfalls angeregt werden.

Abbildung C.3 zeigt, dass es durch diese Resonanz der inneren Strukturen zu einer Strahlungskopplung kommt. Dadurch gibt es eine Bündelung der Abstrahlung in eine oder mehrere Richtungen. In diesem Fall erzeugen die Resonanzen der Leiterbahnen eine Bündelung in zwei verschiedene Richtungen.

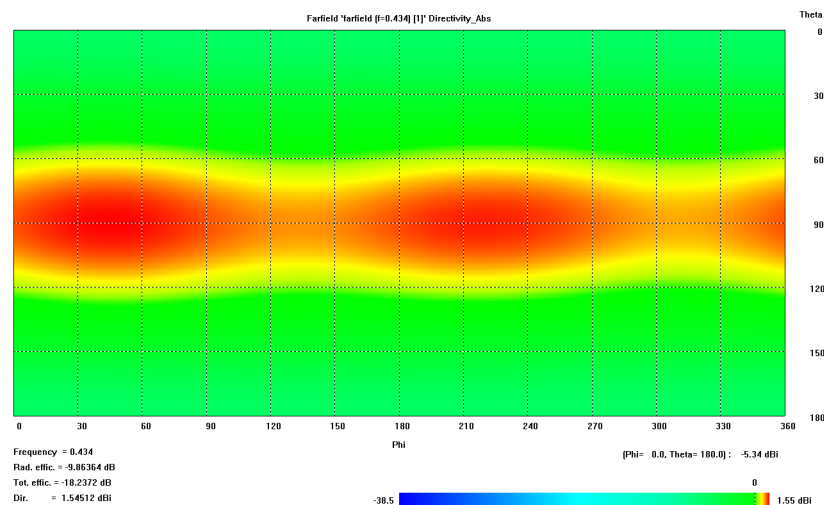


Abbildung C.3.: 2D-Abstrahlcharakteristik bei 434 MHz

Als Vergleich, wurde das gesamte Layout auch bei 509,5 MHz simuliert. Man erkennt in Abbildung C.4 eine deutlich größere Resonanz der Leiterbahnstrukturen als bei der Simulation mit 434 MHz, bedingt durch die geringere Wellenlänge  $\lambda$  bei 509,5 MHz. Dies führt nun zu einer stärkeren Bündelung der Abstrahlung.

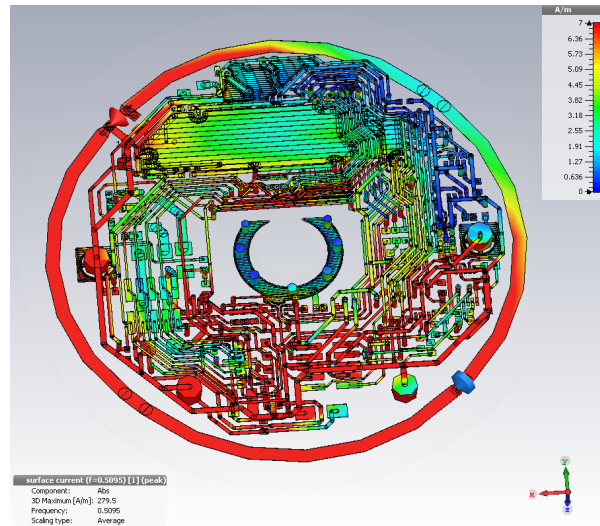


Abbildung C.4.: Platinen-Struktur mit Oberflächenströmen bei 509,5 MHz

Die 2D-Abstrahlcharakteristik bei 509,5 MHz in Abbildung C.5 zeigt den Einfluss dieser Bündelung. Die Abstrahlung der Schleifenantenne wird in eine Richtung gelenkt, wobei es zu einer starken Abschwächung im Bereich von  $\Phi=250^\circ$  kommt.

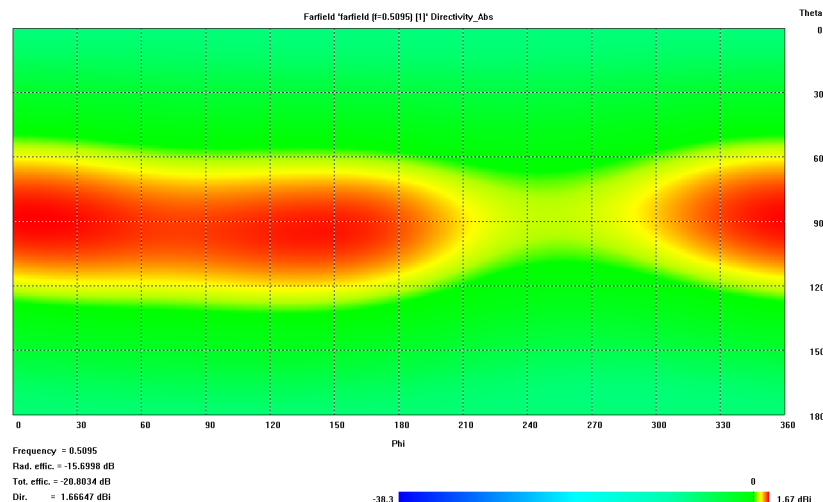


Abbildung C.5.: 2D-Abstrahlcharakteristik bei 509,5 MHz

Um die Ablenkung der Abstrahlung zu verhindern, werden an der Unterseite des Zellsensors jeweils an langen Leitungen, die in der Nähe von  $\lambda/4$  liegen, Induktivitäten angebracht. Die Induktivitäten sollen als Blockade für hochfrequente Signale wirken und dadurch die Abstrahleigenschaft der Leitungsstücke verringern. Für die Simulation wurden dabei 27 nH Induktivitäten eingesetzt.

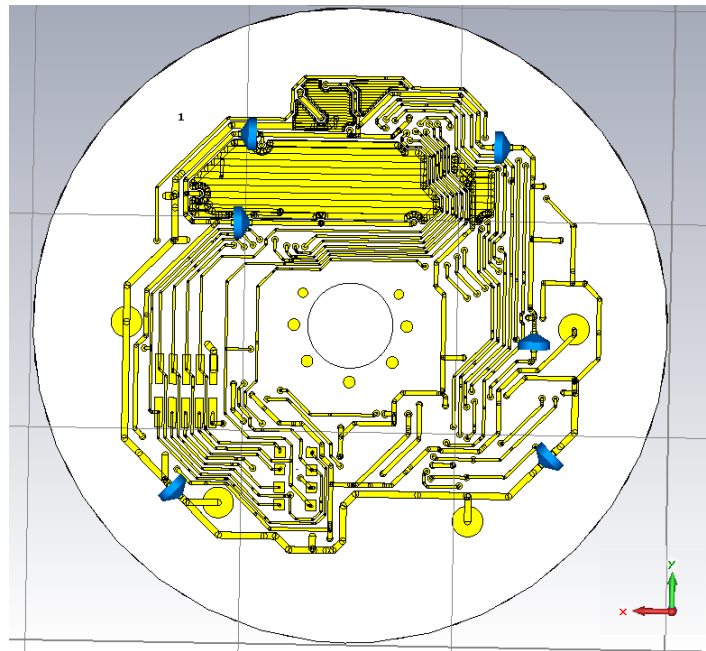


Abbildung C.6.: Platinen-Struktur mit eingebrachten Induktivitäten

Die Stellen, an denen die Induktivitäten eingebracht wurden, sind in Abbildung C.6 mit blauen Pfeilen markiert. Eine Induktivität wurde zusätzlich an der Oberseite angebracht, sodass insgesamt sieben Induktivitäten in das Platinenlayout eingebracht wurden.



Die eingebrachten 27 nH Induktivitäten zeigen eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der resonanten Leiterbahnstrukturen. Die magnetische Feldstärke konzentriert sich hier zum größten Teil auf die äußere Schleifenantenne. Es sind nur noch kleine Leiterbahnstücke, die eine leichte magnetische Feldstärke aufweisen, vorhanden.

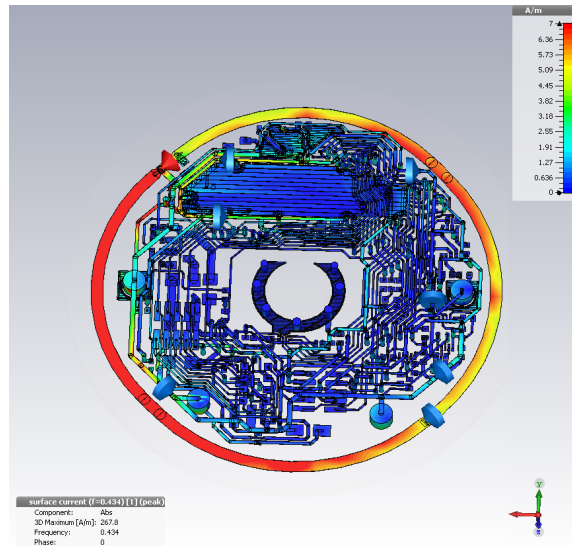


Abbildung C.7.: Überarbeitete Platinen-Struktur mit Oberflächenströmen bei 434 MHz

Das 2D-Abstrahlcharakteristik bei 434 MHz in Abbildung C.8 zeigt, dass die Antenne nun gleichmäßiger abstrahlt als ohne eingesetzte Induktivitäten.

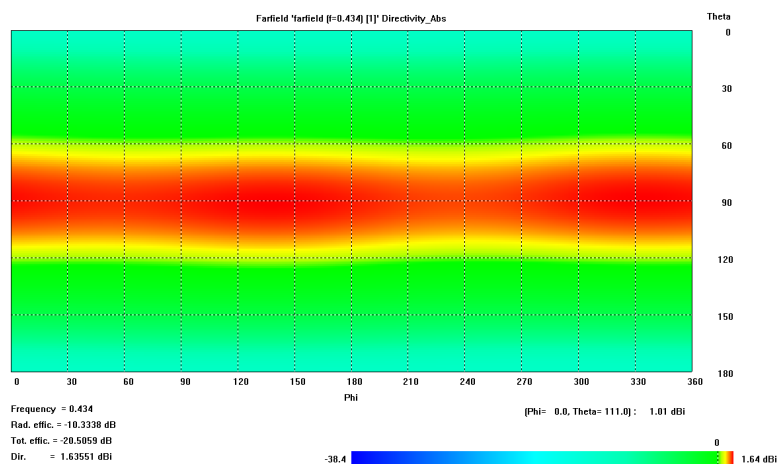


Abbildung C.8.: Korrigiertes 2D-Abstrahlcharakteristik bei 434 MHz

Die 3D-Abstrahlcharakteristik in Abbildung C.9 bei 434 MHz zeigt das erwartete typisch runde Strahlungsdiagramm eines Halbwellendipols.

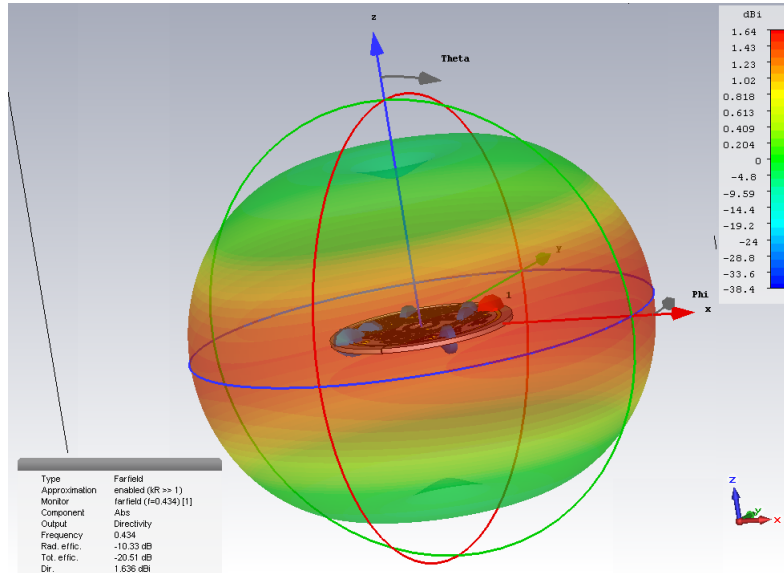


Abbildung C.9.: 3D-Abstrahlcharakteristik bei 434 MHz mit eingesetzten Induktivitäten

Ein Blick in die Theta-Ebene zeigt, dass der Zellsensor horizontal mit max. 1,55 dBi abstrahlt.

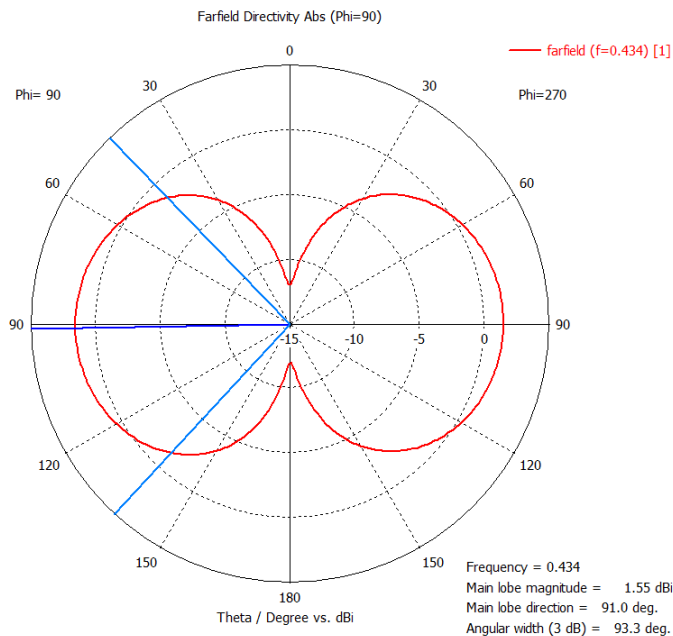


Abbildung C.10.: Richtdiagramm der Schleifenantenne mit eingesetzten Induktivitäten in der Theta-Ebene

Da es sich auf dem Zellsensor noch um eine nicht an  $50\ \Omega$  angepasste Antenne handelt, muss der S-Parameter  $S_{11}$  noch bestimmt werden, um eine optimale Abstrahlwirkung zu erzielen. Der Eingangsreflexionsfaktor  $S_{11}$  in Abhängigkeit von der Frequenz ist in Abbildung C.11 dargestellt. Dabei kann man feststellen, dass die Antenne bei mehreren Frequenzen resonant wird. Eine besonders geringe Eingangsreflexion zeigt die Antenne bei einer Frequenz von 478,8 MHz. Bei den gewünschten 434 MHz hingegen, entsteht eine hohe Reflexion von  $-0,43886\ \text{dB}$ . Dies entspricht einer reflektierten Leistung von ca. 90%, die von der Antenne nicht aufgenommen wird.

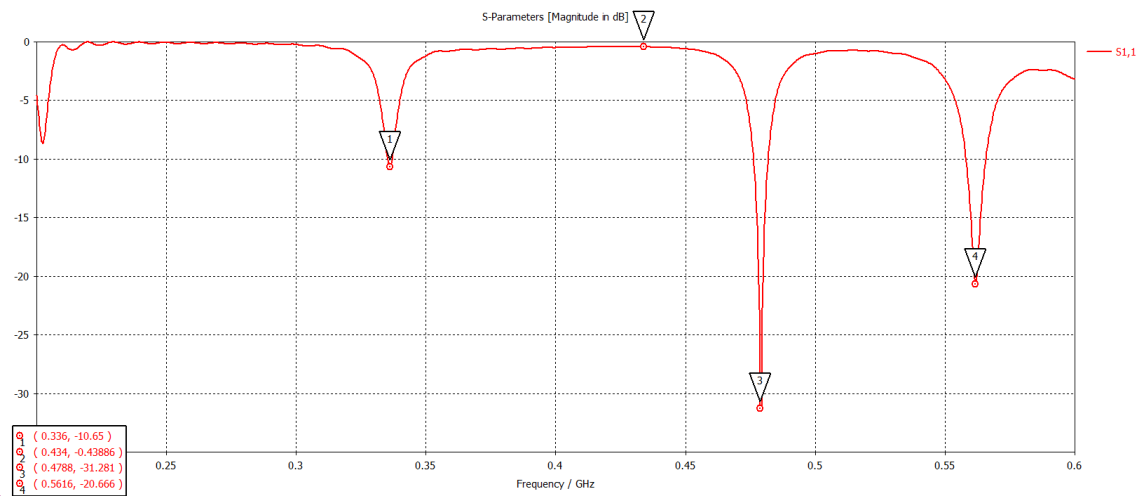


Abbildung C.11.: Streuparameter der Schleifenantenne / CST Microwave Studio

Um eine niedrigere Eingangsreflexion der Antenne bei 434 MHz zu erreichen, muss ein LC-Anpassungsnetzwerk zwischen Schleifenantenne und Antennenumschalter berechnet werden, um die Eingangsimpedanz der Antenne möglichst auf  $50\ \Omega$  zu bringen und somit eine geringere Eingangsreflexion zu erhalten. Eine Berechnung in AWR Design Environment ergab das folgende LC-Anpassungsnetzwerk.

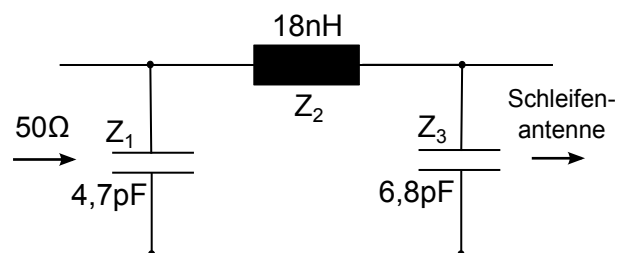


Abbildung C.12.: Errechnetes LC-Anpassungsnetzwerk zwischen Schleifenantenne und Antennenumschalter

Durch das berechnete LC-Anpassungsnetzwerk konnte die Eingangsreflexion bei 434 MHz stark reduziert werden. Diese konnte nun von  $-0,43886$  dB auf  $-17,92$  dB verbessert werden. Dabei reflektiert die Antenne lediglich noch  $1,61\%$  der ankommenden Leistung. Es wird also ca.  $88,7\%$  mehr Leistung von der Antenne aufgenommen als im unangepassten Fall.

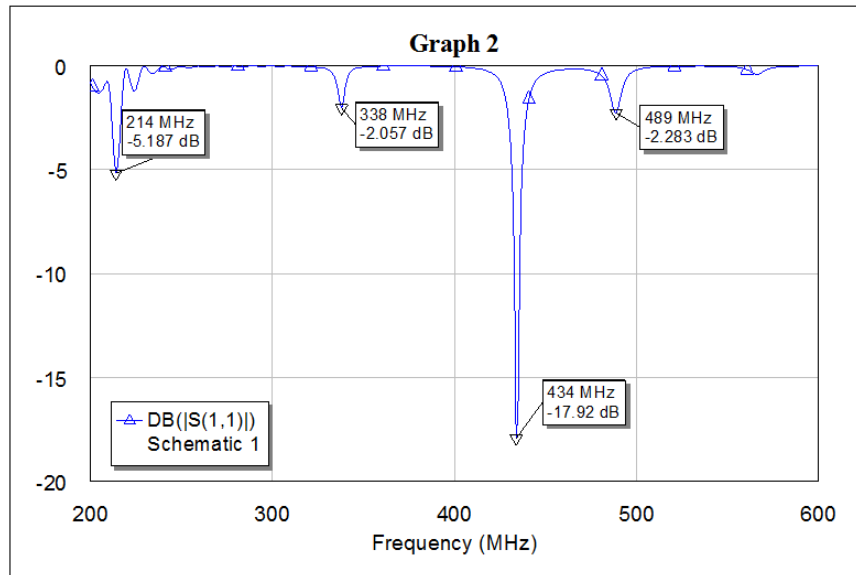


Abbildung C.13.: Optimierte Streuparameter der Schleifenantenne mit LC-Anpassungsnetzwerk/ AWR Design Environment

Ein Vergleich der berechneten Eingangsreflexion mit der Simulierten in Abbildung C.14 zeigt, dass die simulierten Werte gut mit den berechneten Werten übereinstimmen.

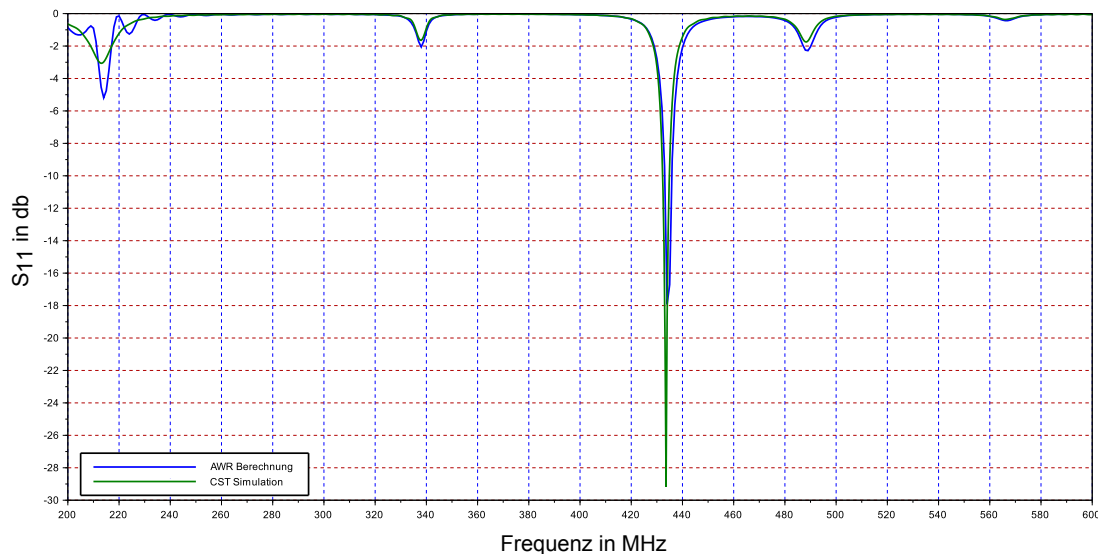


Abbildung C.14.: Streuparametervergleich der simulierten und berechneten  $S_{11}$  Streuparameter

## Simulation des Zellsensors, montiert auf der Batteriezelle

Der Zellsensor soll auf einer Batteriezelle verbaut werden. Befestigt wird dieser mittels eines Befestigungsadapters aus Messing, der den Zellsensor fest mit der Zelle verbindet und als elektrischer Zellanschluss dient.

Da dieser vermutlich Einfluss auf die Abstrahlcharakteristik des Zellsensors haben wird, wird dieser nun im aufgeschraubten Zustand auf der  $\text{LiFePO}_4$  Zelle simuliert.

Der Zellsensor wird dabei mit dem zuvor berechneten LC-Anpassungsnetzwerk und den Induktivitäten in langen Leitungsstücken simuliert.

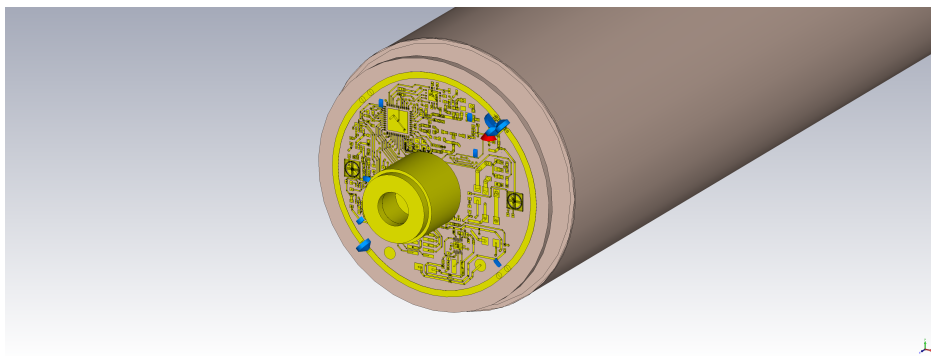


Abbildung C.15.: Aufgeschraubter Zellsensor auf  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle

Im Querschnitt in Abbildung C.16 erkennt man, wie der Zellsensor auf die Zelle aufgebracht wird. Das Zellgehäuse besteht aus einer 1 mm dicken Aluminiumhülle. Der Schraubanschluss der Zelle wurde mit einem 17 mm dicken Zylinder mit einer 8 mm dicken Bohrung modelliert. Der Zellsensor klemmt dabei zwischen Zellanschluss und Adapterstück.

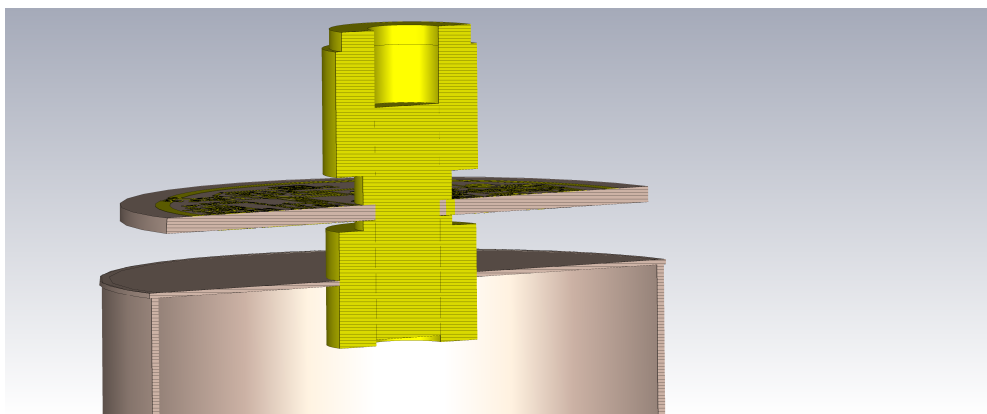


Abbildung C.16.: Querschnitt des aufgeschraubten Zellsensors

Die Simulationsergebnisse zeigen einen leichten Einfluss des Adapterstücks und des Aluminiumzellogehäuses auf die Abstrahlcharakteristik des Zellsensors. Die Abstrahlung liegt hier bei 1,56 dBi.

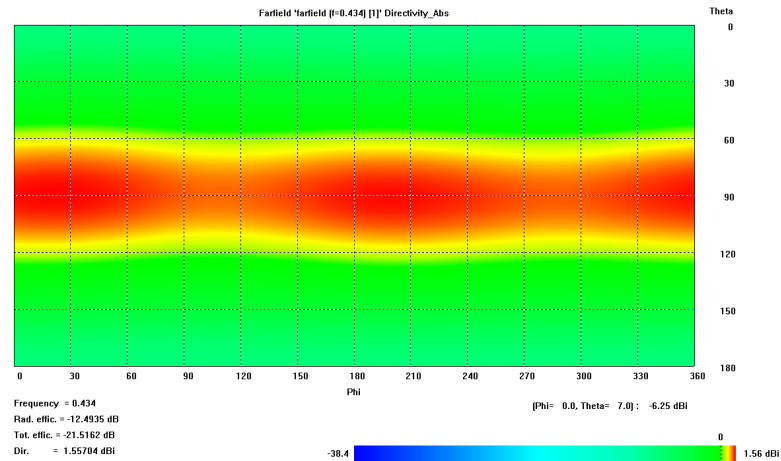


Abbildung C.17.: 2D-Abstrahlcharakteristik des aufgeschraubten Zellsensors

In Abbildung C.18 ist der montierte Zellsensor auf der Batteriezelle und dessen Abstrahlcharakteristik zu sehen.

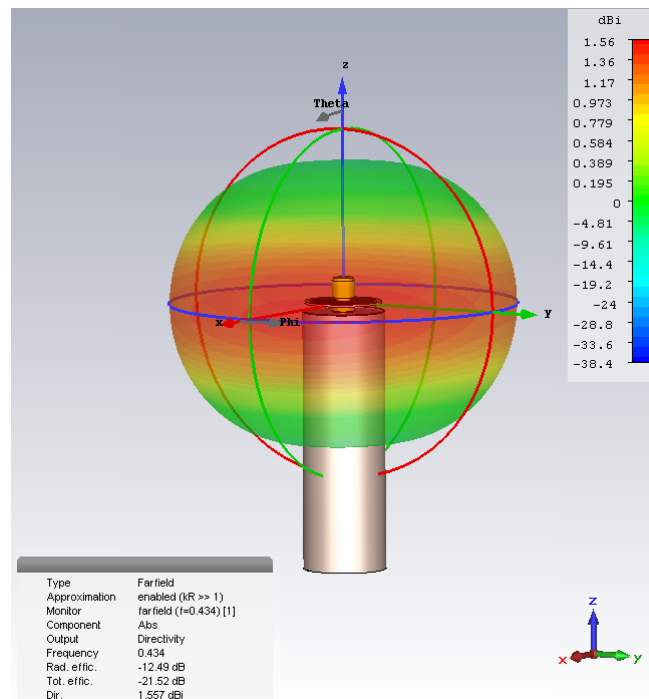


Abbildung C.18.: 3D-Abstrahlcharakteristik des aufgeschraubten Zellsensors

## Simulation mit Epoxydharz

Abschließend wird noch der Einfluss von Epoxydharz auf den Zellsensor simuliert und untersucht. Grund hierfür ist, dass die Elektronik des Zellsensors durch die Aufbringung einer Epoxydharz-Schicht von äußeren mechanischen sowie auch chemischen Einflüssen geschützt werden soll. Dazu wird eine 2 mm dicke Epoxydharz-Schicht auf die Platinenstruktur aufgebracht. Dabei wurde das  $\epsilon_r$  zu 3,6 und das  $\tan\delta_\epsilon$  zu 0,04 gewählt um die Materialeigenschaften des Epoxydharzes zu simulieren [27]. Abbildung C.19 zeigt die aufgetragene Epoxidharz-Schicht auf dem Zellsensor.

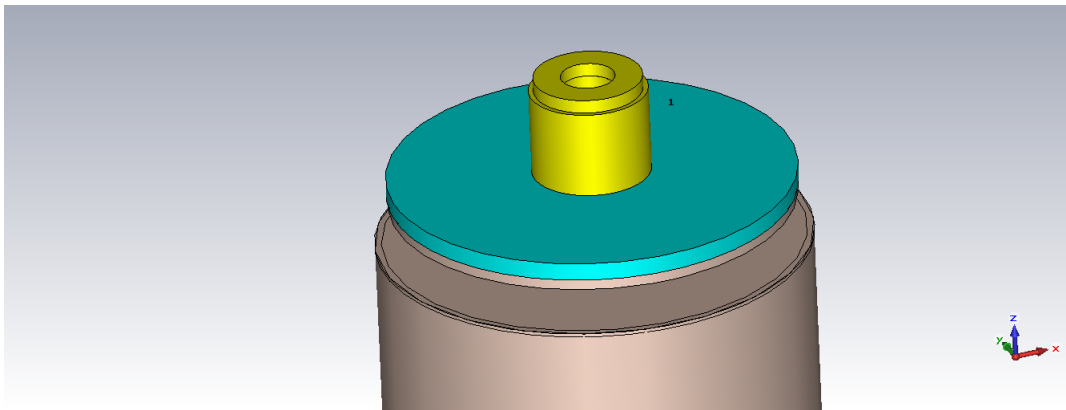


Abbildung C.19.: Zellsensor mit aufgetragener Epoxidharz-Schicht

Die daraus folgende 2D-Abstrahlcharakteristik zeigt die Abbildung C.20.

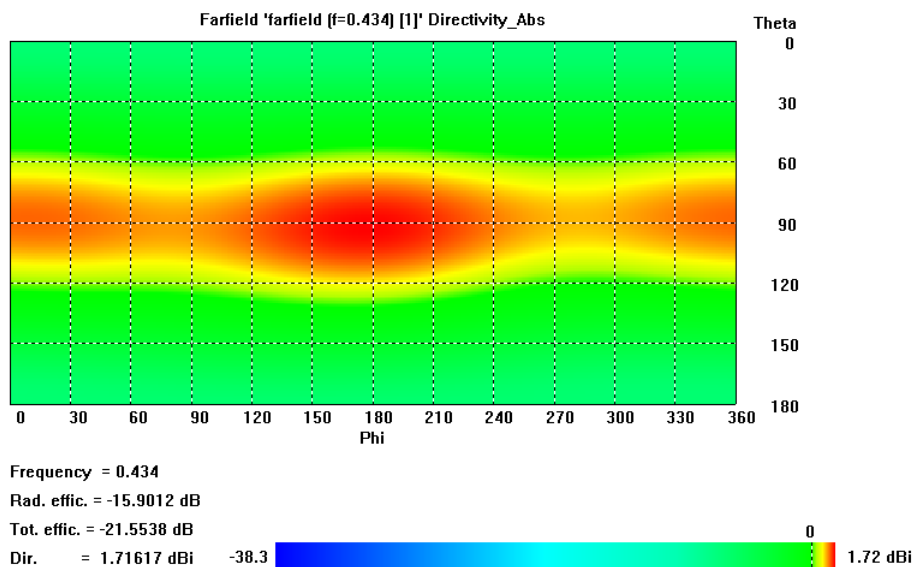


Abbildung C.20.: 2D-Abstrahlcharakteristik des Zellsensors mit Epoxidharz-Schicht

Das Ergebnis dieser Simulation zeigt, dass die aufgebrauchte Epoxidharz-Schicht durchaus einen Einfluss auf die Abstrahlcharakteristik des Zellsensors hat. Dies bestätigen auch die Messungen, welche mit zwei realen Zellsensoren durchgeführt wurden und in Abbildung C.21 zu sehen ist. Dabei wurden ein unvergossener und ein vergossener Zellsensor im Abstand von 50 cm zu einem Spektrum-Analysator aufgestellt und vermessen. Beide sendeten dabei ein kontinuierliches Trägersignal ab, welches vom Spektrum-Analysator empfangen wurde. Dabei konnte ebenfalls ein Einfluss festgestellt werden, welcher sich in unterschiedlichen Empfangsleistungen darstellte. Eine Richtwirkung des Zellsensors konnte damit aber nicht nachgewiesen werden, dazu sind weitere Messungen in einer Antennen-Messhalle notwendig.

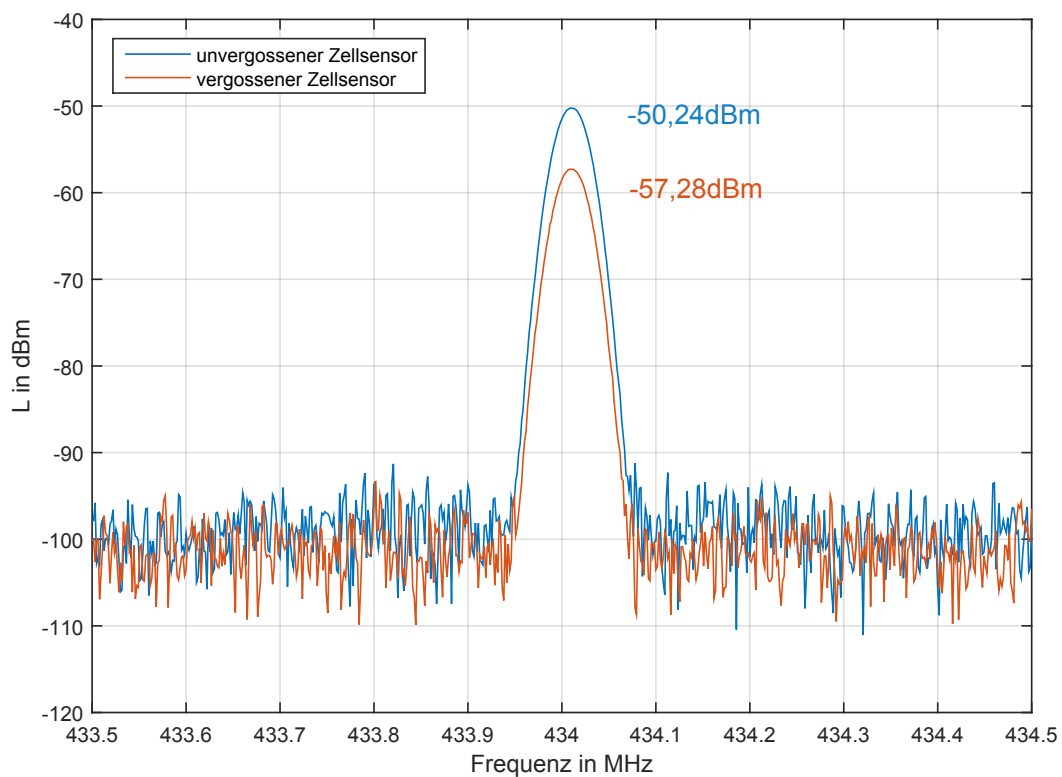


Abbildung C.21.: Vergleich zwischen vergossenem und unvergossenem Zellsensor

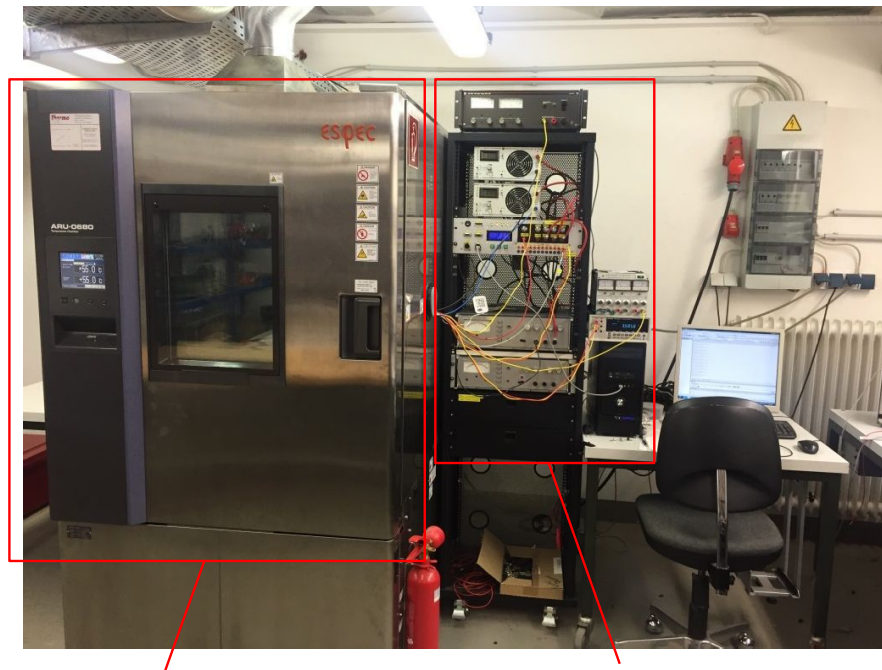


## D. Alterung einer Batteriezelle

In diesem Kapitel wird die künstliche Alterung einer Batteriezelle vorgestellt, welche im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde.

Um zu untersuchen, wie sich das Impedanzspektrum einer  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle über die Zeit verändert, wurde eine künstliche Alterung einer Zelle durchgeführt. Dabei ist aus der Literatur bekannt, dass eine Alterung durch Zugabe von Temperatur teilweise stark beschleunigt werden kann [26]. Es wird berichtet, dass die SEI-Dicke mit zunehmender Temperatur stark anwächst [45]. Dies führt zu einem zunehmenden Kapazitätsverlust sowie einer Erhöhung des Innenwiderstands und somit zu einer Alterung der Zelle.

Eine solche künstliche Alterung wurde nun in einem mehrwöchigen Test durchgeführt. Das Impedanzspektrum der alternden Batteriezelle wurde dabei jede Woche durch das FuelCon TrueData-EIS vermessen. Durch das Lagern einer Batteriezelle bei einer Umgebungstemperatur von  $55^\circ\text{C}$  in einem Temperaturschrank wurde versucht, diese Alterung zu beschleunigen. Neben der Temperierung wurde die Batteriezelle dabei zyklisch aufgeladen und anschließend entladen. Dadurch erhielt die Zelle 100 volle Ladezyklen pro Woche. Dies sollte ebenfalls der schnelleren Alterung der Zelle dienen. Den technischen Aufbau zur künstlichen Alterung zeigt Abbildung D.1.



Temperaturschrank

Batterie-Zyklierer Anlage

Abbildung D.1.: Aufbau zur künstlichen Batteriezellen-Alterung

Für die Vermessung der Zelle wurde diese einmal pro Woche aus dem Temperaturschrank entnommen damit diese auf Zimmertemperatur abkühlen konnte. Anschließend wurde die Zelle vermessen. Es wurde darauf geachtet, dass die Zelle bei der Vermessung den annähernd selben Ladungszustand hatte. Abbildung D.2 zeigt die Ergebnisse der sieben Wochen langen künstlichen Alterung.

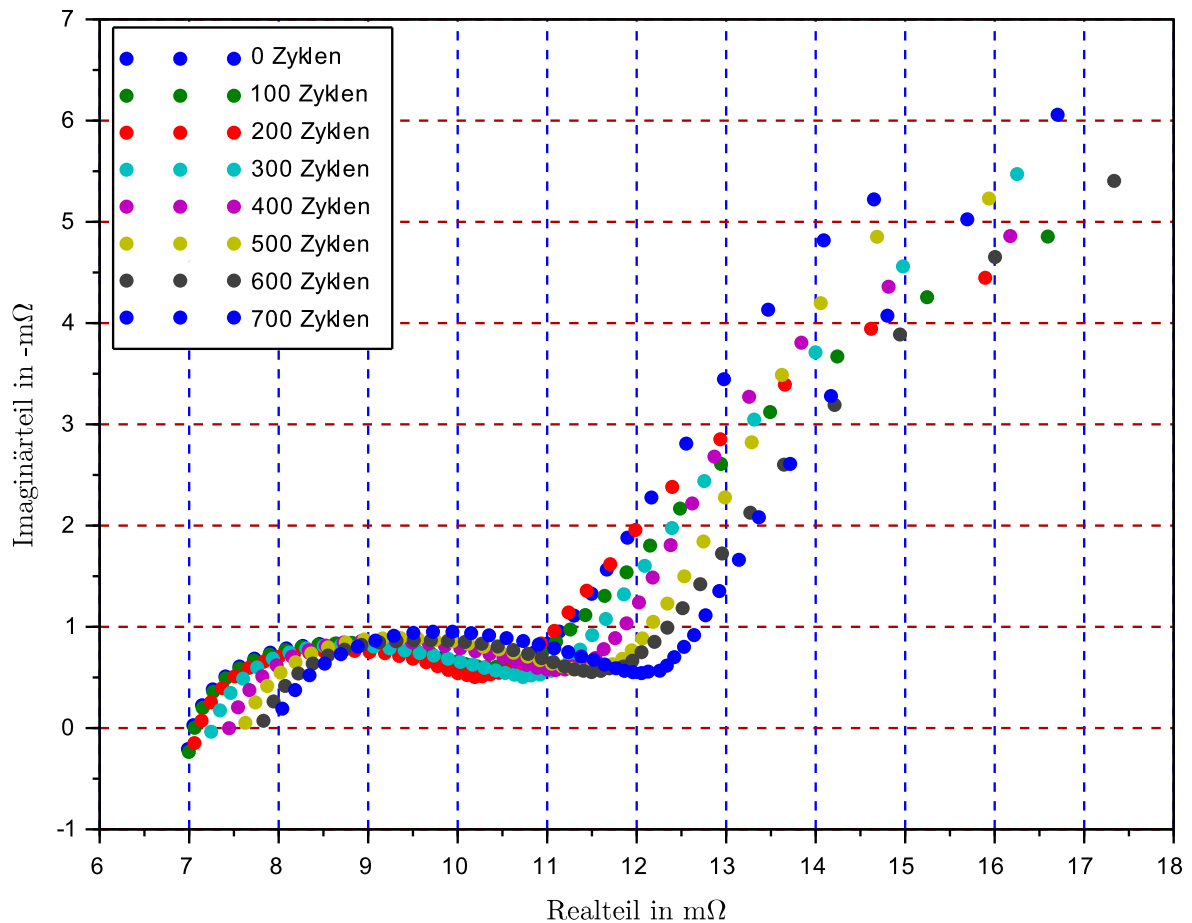


Abbildung D.2.: Künstliche Alterung einer  $\text{LiFePO}_4$ -Zelle

Dabei ist zu sehen, dass sich die Impedanzkurve mit zunehmender Alterung nach rechts bewegt. 100 Zyklen entsprechen dabei einer Woche der künstlichen Alterung.

# E. Impedanzmessung

## Ladungsabhängige Impedanzmessungen

Die Abbildung E.1 zeigt die vollständige Aufnahme der ladungsabhängigen Impedanzmessungen. Diese Messungen wurden mittels des FuelCon TrueData-EIS aufgenommen. Dabei wurden jeweils 40 Frequenzpunkte zwischen 3.000 Hz und 10 mHz vermessen.

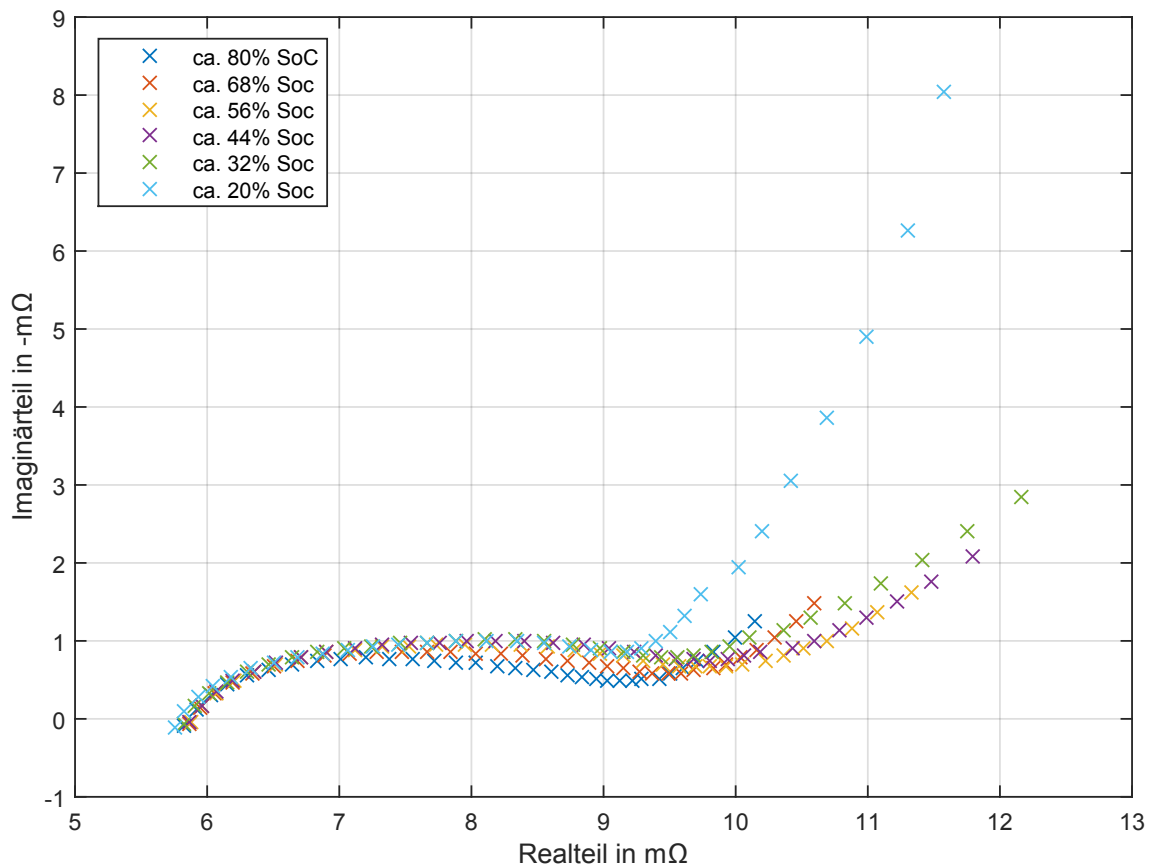


Abbildung E.1.: Ladungsabhängige Impedanzmessungen mit FuelCon TrueData-EIS

Abbildung E.2 zeigt die Vergleichsmessung zur ladungsabhängigen Impedanzmessung mit dem in dieser Arbeit entwickelten Messsystem.

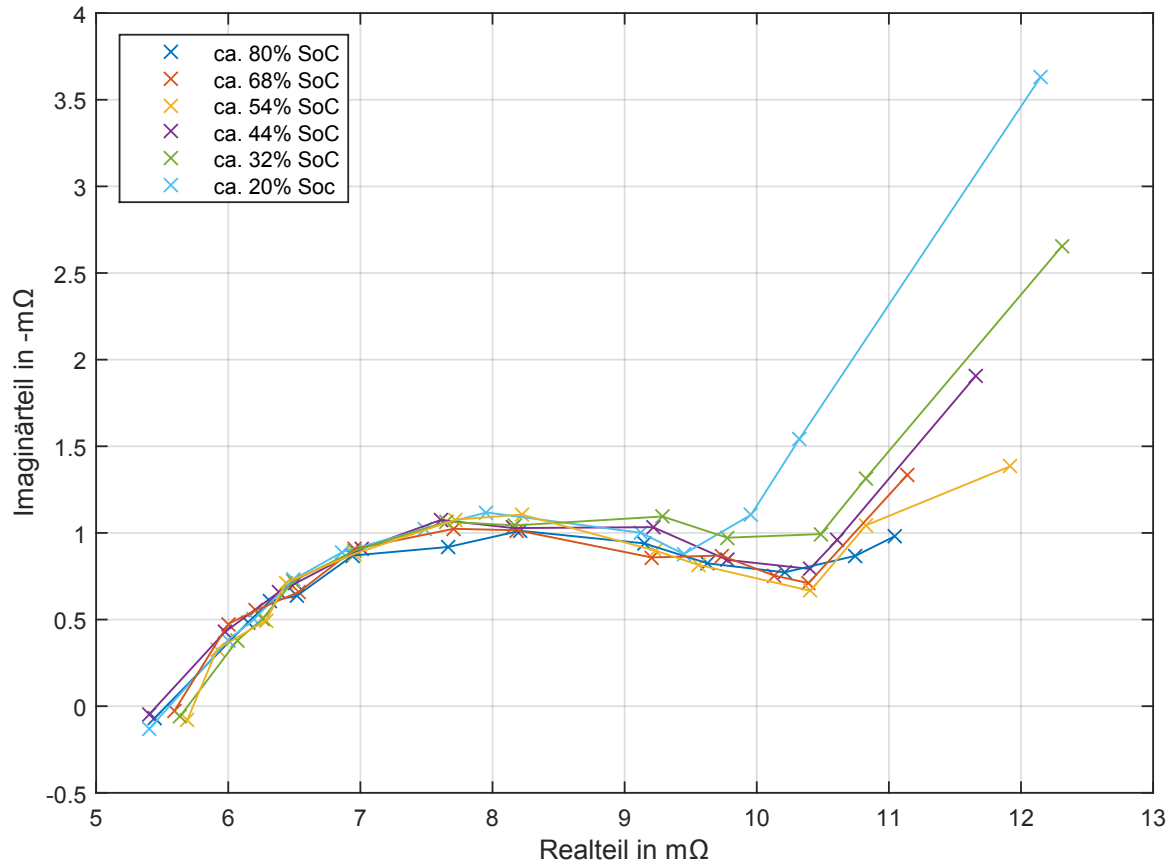


Abbildung E.2.: Ladungsabhängige Impedanzmessungen mit Zellsensoren und Batterie-steuerggerät

**Impedanzmessungen an ECC-LFPP 45 Ah Zellen**

Aufgenommen wurden diese Messungen mit dem FuelCon TrueData-EIS mit 40 Messpunkten zwischen 3 kHz und 10 mHz.

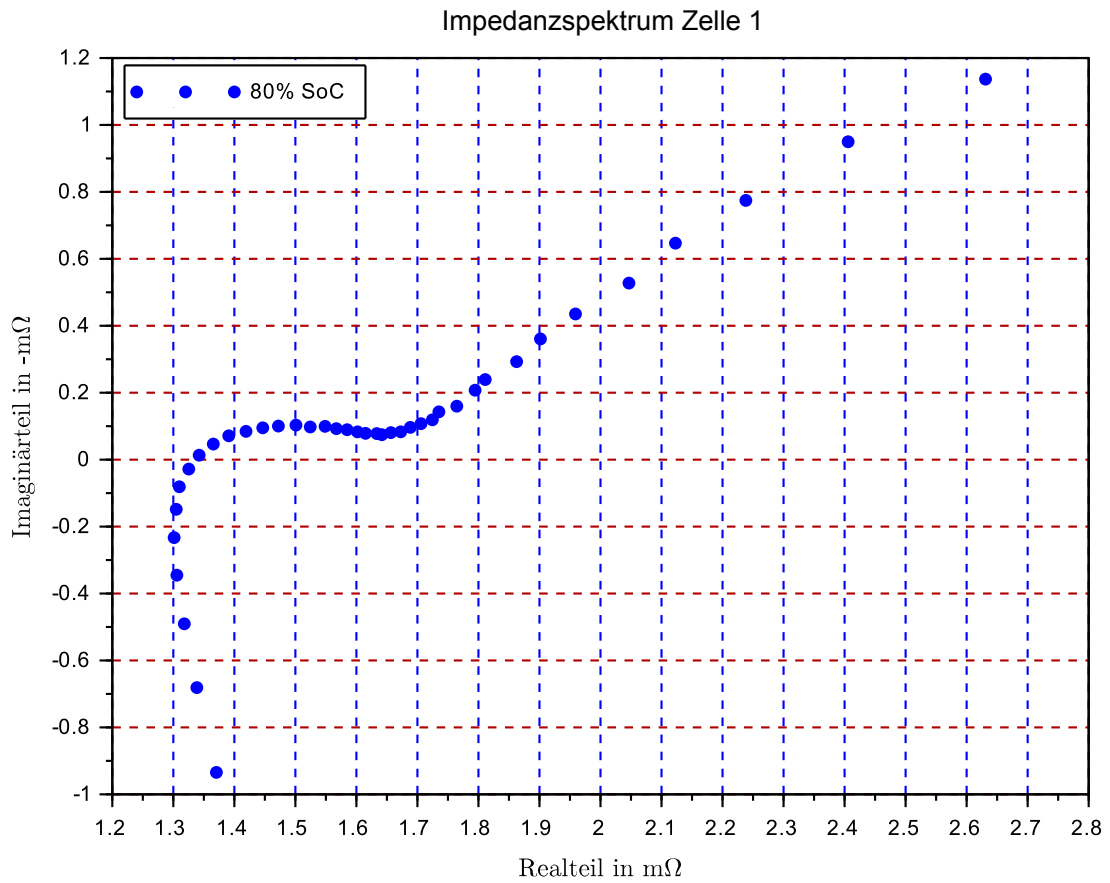


Abbildung E.3.: Impedanzmessungen an ECC-LFPP 45 Ah Zelle 1

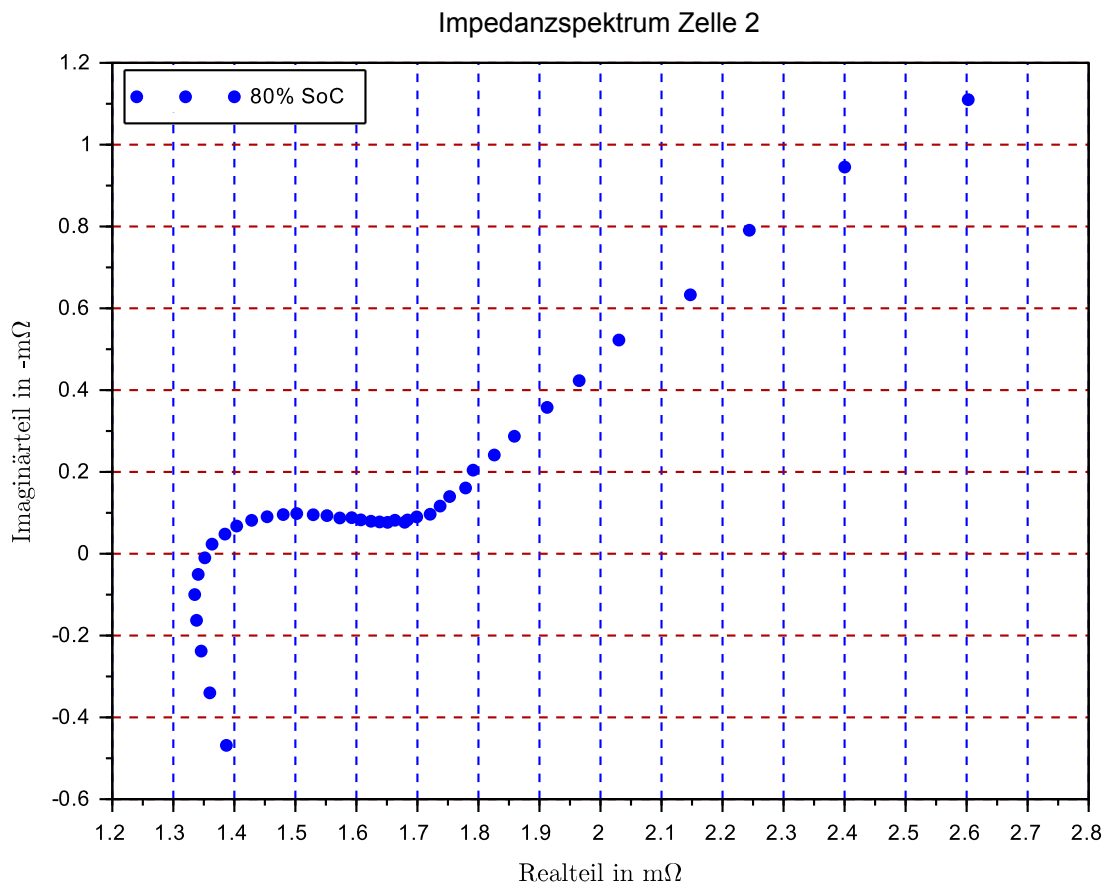


Abbildung E.4.: Impedanzmessungen an ECC-LFPP 45 Ah Zelle 2

## F. Befehlsübersicht Batteriesteuergerät

Dieser Abschnitt soll zeigen, mit welchen Befehlen sich das Batteriesteuergerät und die Zellsensoren bedienen lassen.

Das Batteriesteuergerät lässt sich unter den folgenden Einstellungen mit einem Computer verbinden:

- 56.000 Baud
- 8 Data Bit
- 1 Stop Bit
- keine Paritätsbits
- Zeilenumbruch mit CR+LF

Zu beachten ist bei der Verbindung, dass das Batteriesteuergerät zunächst mit der Geschwindigkeit von 9.600 Baud verbunden werden muss, bevor auf 56.000 Baud umgestellt werden kann. Eine direkte Verbindung mit 56.000 Baud ist nicht möglich.

Im Folgenden sind die einzelnen Befehle und die dazugehörigen Parameter aufgeführt.

### **Einzelne Spannungsdaten abrufen**

Um die einzelnen Spannungsdaten eines bestimmten Zellsensors abzurufen, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

`get_voltage(HEX)` (F.1)

HEX steht dabei für die Adresse des Zellsensors. So ist für den Spannungsabruf von Zellsensor Nr. 0x01, `get_voltage(01)` einzugeben. Dieser antwortet nach erfolgreicher Übertragung mit dem aufgenommenen Spannungswert.

### **Burstmessung starten**

Um eine Burstmessung zu starten, ist der folgende Befehl einzugeben:

`burst(INT1,INT2)` (F.2)

Dabei steht INT1 für die Abtastfrequenz. INT2 gibt die Anzahl der aufzunehmenden Samples an.

### **Burstmessung abrufen**

Um die Rohdaten der Burstmessung abzurufen, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

get\_burst(HEX) (F.3)

HEX steht dabei für die Adresse des Zellsensors. Als Rückgabewert werden zuerst die aufgenommenen Messdaten des entsprechenden Zellsensors ausgegeben. Der letzte Wert der Übertragung gibt den HEX-Wert des Verstärkungs-Rheostaten an, der bei dieser Messung verwendet wurde. Anschließend werden die Roh-Daten der Strommessung übertragen.

### **Aktuelle Konfiguration des Zellsensor oder des Batteriesteuergerät abrufen**

Um die aktuelle Konfiguration des Zellsensor oder des Batteriesteuergeräts abzurufen, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

get\_config(HEX) (F.4)

Rückgabewert ist die aktuelle Konfiguration des Zellsensors bzw. des Batteriesterngeräts. Für den Abruf der Batteriesteuergerät-Konfiguration wird als HEX-Wert 00 eingegeben. Ansonsten die Adresse des Zellsensors.

### **HEX Werte senden**

Diese Funktion sendet vier verschiedene HEX-Werte als Broadcast-Message und wurde für Testzwecke implementiert.

send\_hex(HEX,HEX,HEX,HEX) (F.5)

### **Dynamische Laufzeitmessung durchführen**

Um die dynamische Laufzeitmessung durchführen, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

cali\_burst(HEX) (F.6)

HEX steht dabei für die Adresse des Zellsensors. Als Rückgabewert wird zunächst die gemessene Zeit des Batteriesteuergerät zurückgegeben, anschließend die Zeit des Zellsensors.

### **DCO-Takt des Zellsensor kalibrieren**

Um den DCO-Takt des Zellsensors zu kalibrieren, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

cali\_clk(HEX) (F.7)



HEX steht dabei für die Adresse des Zellsensors. Die Kalibrierung wird solange durchgeführt, bis der DCO-Takt des Zellsensor innerhalb der vorgegeben Toleranz liegt.

#### **Analoge Vorverarbeitung manuell einstellen**

Um die analoge Vorverarbeitung manuell einzustellen, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

`set_ad5270_zs(HEX1,HEX2,HEX3)` (F.8)

HEX steht dabei für die Adresse des Zellsensors. HEX2 gibt den einzustellenden Wert für den Rheostaten in der Subtrahierschaltung an. HEX3 gibt den einzustellenden Wert für den Rheostaten in der Verstärkerschaltung an.

#### **Analoge Vorverarbeitung automatisch einstellen**

Um die analoge Vorverarbeitung automatisch einzustellen, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

`set_preprocessing(HEX)` (F.9)

HEX steht dabei für die Adresse des Zellsensors.

#### **DFT-Werte der Burstmessung abrufen**

Um die DFT-Werte der Burstmessung abrufen, ist der folgende Befehl an das Batteriesteuergerät zu senden:

`set_goertzel(HEX,INT1,INT2,INT3)` (F.10)

HEX steht dabei für die Adresse des Zellsensors. INT1 steht für die Anzahl, der für die Berechnung verwendeten Perioden. INT2 steht für die bei der Messung verwendeten Burstfrequenz. INT3 steht für die bei der Messung verwendeten Messfrequenz.

Tabelle F.1.: Befehlsübersicht für das Batteriesteuergerät

<b>Befehl</b>	<b>Übergabeparameter</b>	<b>Übergabetyp</b>
help		help
get_voltage	ZS Adresse	HEX
burst	Burstfrequenz und Anzahl Sample	Integer
get_burst	ZS Adresse	HEX
get_config	Adresse	HEX
send_hex	Vier HEX Werte	HEX
set_brake	Übertragungsrate	Integer
cali_burst	ZS Adresse	HEX
cali_clk	ZS Adresse	HEX
set_ad5270_zs	ZS Adresse und Werte des Rheostaten	HEX
get_goertzel	Senden der DFT Werte	HEX und Integer

## G. Befestigungsadapter

Zur mechanischen und elektrischen Verbindung des Zellsensors mit einer ECC-LFPP 45Ah LiFePO<sub>4</sub>-Zelle wurde ein Adapter entworfen. Konstruiert wurde der Befestigungsadapter von M. Eng. Christian Starcken. Abbildung G.1 zeigt den Befestigungsadapter.

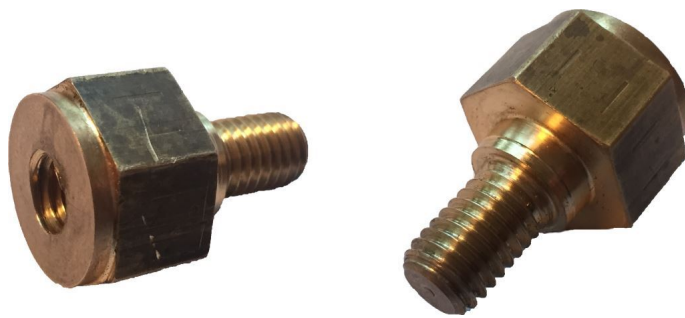
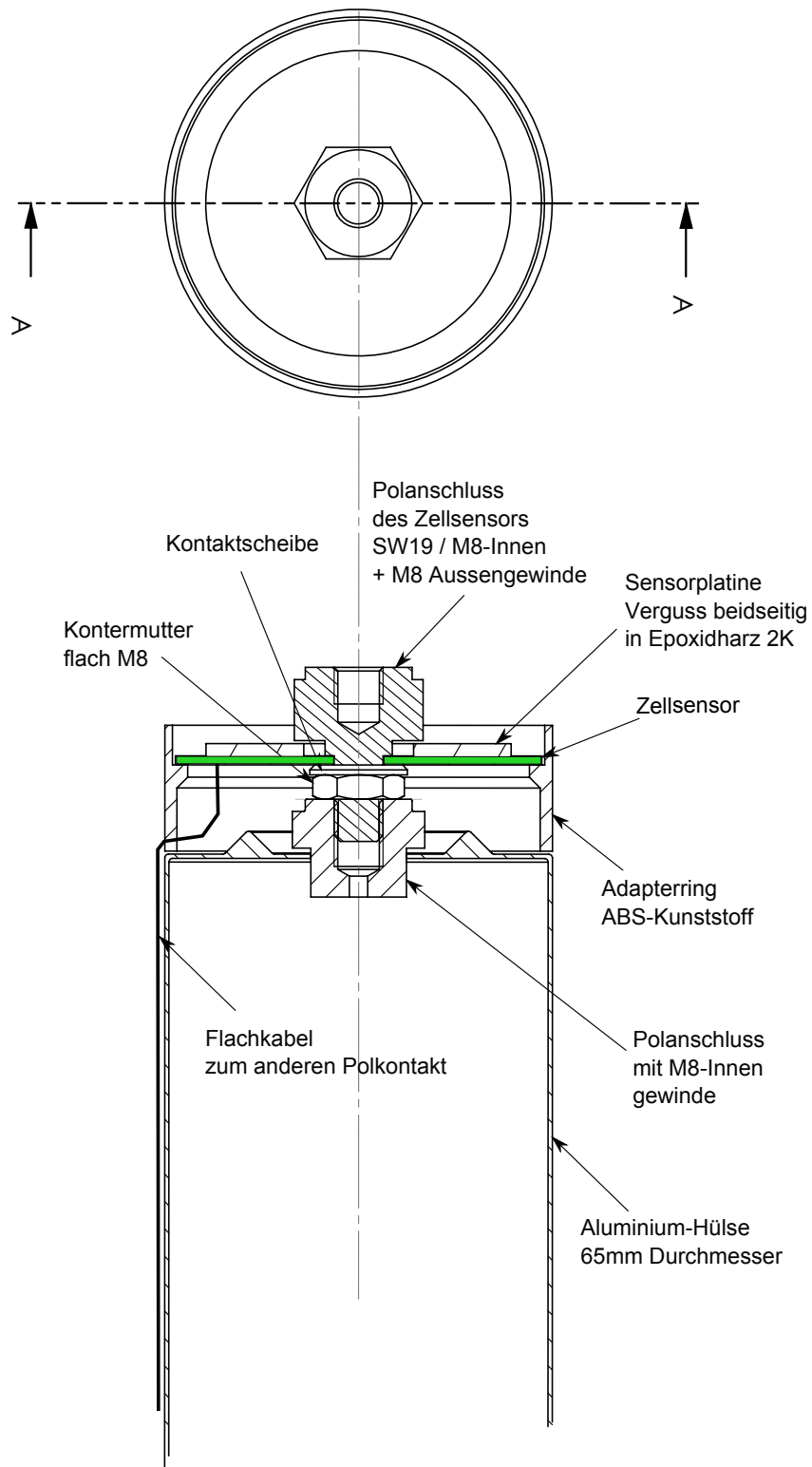


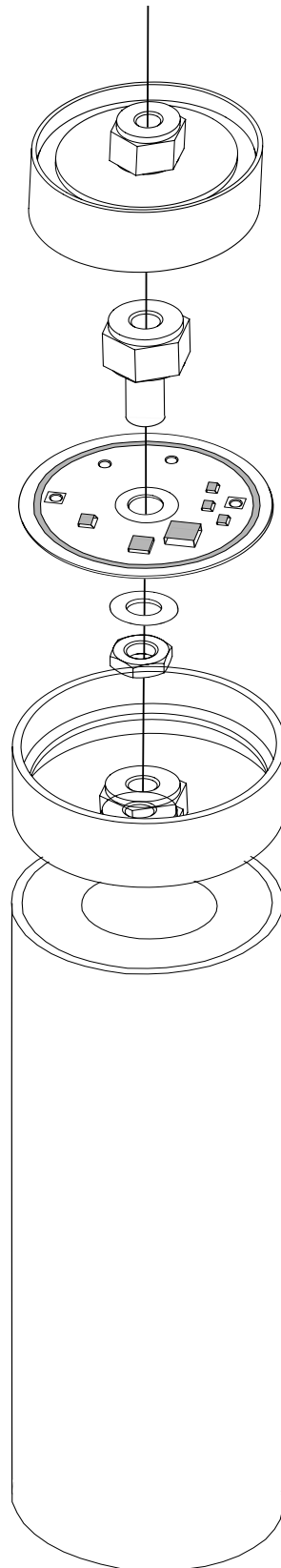
Abbildung G.1.: Befestigungsadapter

In der folgenden Abbildung G.2 ist der montierte und vergossene Zellsensor auf einer ECC-LFPP 45Ah LiFePO<sub>4</sub>-Zelle zu sehen.



Abbildung G.2.: Montierter und vergossener Zellsensor auf einer ECC-LFPP 45Ah LiFePO<sub>4</sub>-Zelle

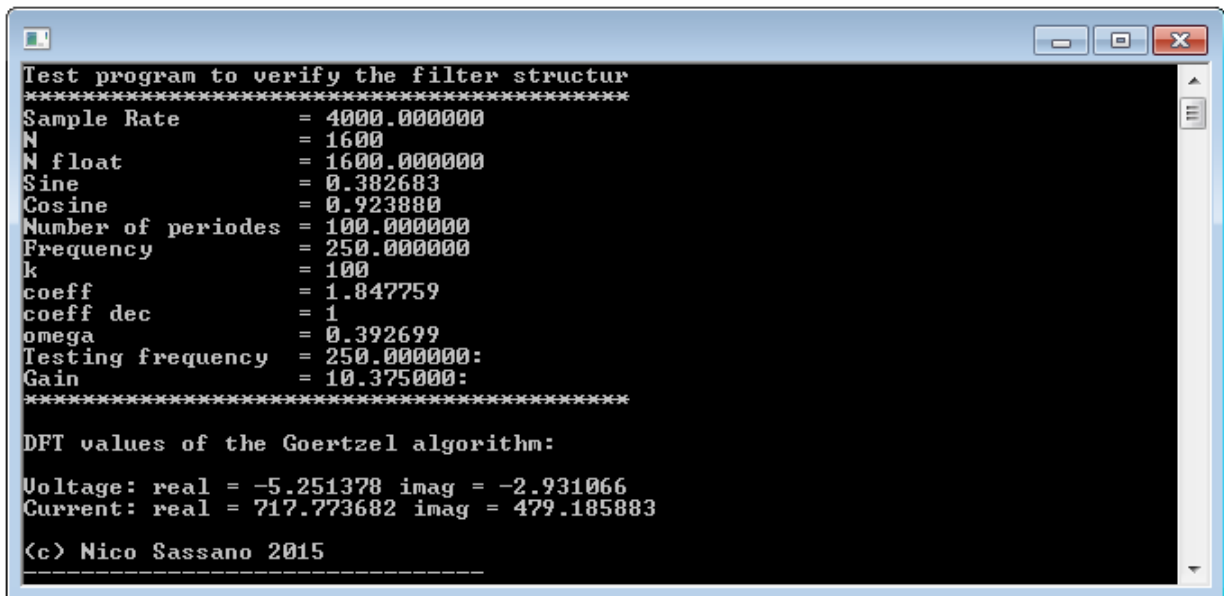




## H. PC-lauffähiges Goertzel-Testprogramm

Zur ersten Verifizierung der entwickelten Goertzel-Filterstruktur, wurde zunächst ein PC-Lauffähiges Programm geschrieben. Ein Grund für das spezielle Programm ist, dass es auf dem Mikrocontroller sehr aufwendig ist, eine große Anzahl verschiedener Messdaten zu implementieren und diese zu testen, bedingt durch den begrenzten Speicher des Mikrocontrollers. Aufgebaut wurde die Filterstruktur wie in Abschnitt 5.3 beschrieben.

Das Testprogramm mit den dazugehörigen Messdaten befindet sich auch auf der beiliegenden CD. Der Quellcode des Goertzel Testprogramms findet sich im Anschluss der Abbildung H.1, welches die Konsolenausgabe des zeigt.



```
Test program to verify the filter structur
*****
Sample Rate      = 4000.000000
N                = 1600
N float         = 1600.000000
Sine            = 0.382683
Cosine          = 0.923880
Number of periodes = 100.000000
Frequency        = 250.000000
k               = 100
coeff           = 1.847759
coeff dec       = 1
omega           = 0.392699
Testing frequency = 250.000000:
Gain            = 10.375000:
*****

DFT values of the Goertzel algorithm:

Voltage: real = -5.251378 imag = -2.931066
Current: real = 717.773682 imag = 479.185883

<c> Nico Sassano 2015
```

Abbildung H.1.: PC lauffähiges Goertzel-Testprogramm

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 #define Fs 4000.0
5 #define f 250.0
6 int u_int[1992] = { Daten auf beiliegender CD };
7 int i_int[2000] = { Daten auf beiliegender CD };
8
9 float u[2000];
10 float i[2000];
11
12 int main(void) {
13
14     int index;
15     int k;
16     int N_int;
17     int coeff_dec = 0;
18
19     float real_u;
20     float imag_u;
21     float real_i;
22     float imag_i;
23     float bn_0 = 0;
24     float bn_1 = 0;
25     float bn_2 = 0;
26     float N_float;
27     float omega;
28     float sine;
29     float cosine;
30     float coeff;
31     float steps;
32     float m;
33     float Np;
34
35     m = 100; // Anzahl der Perioden pro Berechnung
36     Np = Fs/f; // Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
37     N_float = m * Np; // Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
38     N_int = (int) N_float;
39
40     //0.00080586
41     for(index = 0; index < N_int+1; index++) {
42         i[index] = ((3.3/4095)*i_int[index])*10;
43     }
44
45     float gain = 0.0;
46     gain = (1+((96.0*(100000.0/1024.0)+000)/ 1000));
47
48     for(index = 0; index < N_int+1; index++) {
49         u[index] = ((2.50/4095)*u_int[index])/gain;
50     }
51
52     /*** Begin the Goertzel algorithm ***/
53     k = (int) (0.5 + ((N_float * f) / Fs));
54     omega = (2.0 * M_PI * k) / N_float;
55     sine = sin(omega);
56     cosine = cos(omega);
57     coeff = 2.0 * cosine;
58     coeff_dec = (int) coeff;
59
60     for (index = 0; index < N_int + 1 ; index++) {
61         if(index == N_int) {
62             bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + 0;
63         } else {
64             bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + u[index];
65         }
66         bn_2 = bn_1;
67         bn_1 = bn_0;
68     }
69
70     real_u = (bn_1 - bn_2 * cosine);
71     imag_u = (bn_2 * sine);
72
73     bn_0 = 0;
74     bn_1 = 0;
75     bn_2 = 0;
76
77     for (index = 0; index < N_int + 1 ; index++) {
78         if(index == N_int) {
79             bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + 0;
80         } else {
81             bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + (float) i[index];
82         }
83
84         bn_2 = bn_1;
85         bn_1 = bn_0;

```

```
86     }
87
88     real_i = (bn_1 - bn_2 * cosine);
89     imag_i = (bn_2 * sine);
90
91     /** End the Goertzel algorithm */
92     printf("Test program to verify the filter structur\n");
93     printf("*****\n");
94     printf("Sample Rate      = %f\n", Fs);
95     printf("N                    = %d\n", N_int);
96     printf("N float              = %f\n", N_float);
97     printf("Sine                  = %f\n", sine);
98     printf("Cosine                 = %f\n", cosine);
99     printf("Number of periodes = %f\n", m);
100    printf("Frequency             = %f\n", f);
101    printf("k                      = %d\n", k);
102    printf("coeff                  = %f\n", coeff);
103    printf("coeff dec              = %d\n", coeff_dec);
104    printf("omega                  = %f\n", omega);
105    printf("Testing frequency     = %f:\n", f);
106    printf("Gain                   = %f:\n", gain);
107    printf("*****\n");
108
109    printf("\nDFT values of the Goertzel algorithm:\n");
110    printf("\n");
111    printf("Voltage: real = %f imag = %f\n", real_u, imag_u);
112    printf("Current: real = %f imag = %f\n", real_i, imag_i);
113    printf("\n(c) Nico Sassano 2015");
114
115    return 0;
116 }
```



# **I. Aufgabenstellung**



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
Department Informations- und Elektrotechnik  
Prof. Dr.-Ing. Karl-Ragmar Riemschneider

15. Februar 2015

## **Masterthesis Nico Sassano**

# **Entwicklung eines Messsystems zur funksynchronisierten elektrochemischen Impedanzspektroskopie an Batterie-Zellen**

### **Motivation**

In der Forschungsgruppe 'Batteriesensoren - BATSEN' werden an der HAW Hamburg Sensoren und Verfahren entwickelt, die Aussagen über den Ladezustand und die Alterung von Batterien ermöglichen sollen. Hierzu sollen die drahtlos kommunizierende Sensoren die Spannung und die Temperatur der Batteriezellen messen. Diese Informationen werden drahtlos an ein für die Gesamtbatterie zuständiges Steuergerät übertragen. Auswertelgorithmen kombinieren diese Sensordaten mit einer zentralen Strommessung und schätzen den Batteriezustand.

Aus der Literatur ist bekannt, dass der komplexe Innenwiderstand der Zellen eine differenzierte Aussage über das Verhalten der Batteriezellen zulässt. Hierfür wird das Verfahren der elektrochemischen Impedanzspektroskopie (EIS) eingesetzt. Es hat sich als Messverfahren bei der Entwicklung von neuen Batterie-Technologien etabliert. Die EIS erlaubt separierbare Rückschlüsse auf verschiedene Vorgänge innerhalb der Batterie. Bisher werden für die EIS spezialisierte Laborgeräte eingesetzt, welche für eine Betriebsüberwachung im Einsatzfall im Fahrzeug zu aufwändig sind.

Das Projekt BATSEN strebt an, diesen Aufwand deutlich zu senken. Hierfür sollen die drahtlosen Zellsensoren befähigt werden, die EIS-Messungen zu unterstützen. Ein Fernziel ist die Verwendung nicht nur im Laborgerät sondern als Teil des Batteriemagementsystems in Elektrofahrzeugen.

### **Aufgabe**

Herr Nico Sassano erhält die Aufgabe, einen bestehenden Zellsensor für die Durchführung der EIS an Batteriezellen zu erweitern.

Er kann dabei auf Vorarbeiten aus der Arbeitsgruppe BATSEN zurückgreifen, sowohl der Entwurf von Zellsensoren als auch Voruntersuchungen und Implementierungsschritte für elektrochemische Impedanzspektroskopie sind bearbeitet worden. Obwohl dort viele Teilaspekte behandelt wurden, konnte eine vollständige Impedanzspektroskopie noch nicht realisiert werden.

Wichtig ist, dabei vergleichbare Leistungsparameter wie die Laborgeräte zu erfüllen und die Anforderungen für die im Fahrzeug verwendeten großen LiFePo<sub>4</sub>-Zellen abzudecken. Laut der aktuellen Literatur werden für die EIS Wechselspannungen mit der Frequenz von einigen mHz bis hin von mehreren kHz benutzt. Zudem kann diese Wechselspannung eine Offsetspannung von mehr als 4V und eine sehr kleine Amplitude von wenigen mV besitzen. Der Zellsensor soll in der Lage sein, diese Wechselspannung ausreichend aufgelöst zu messen und zu verarbeiten. Hierzu ist der ADC und/oder die analoge Vorverarbeitung der Sensoren anzupassen. Neben der Entwicklung des Zellsensors, der diese Forderungen erfüllen soll, ist ein leistungsfähiges Batteriesteuergerät zu entwickeln. Dieses Steuergerät soll neben der drahtlosen Kommunikation mit den Zellsensoren auch in der Lage sein, den gesamten Strom, der durch die gesamte Batterie fließt, zu messen. Ein zu lösendes Kernproblem ist die phasenrichtige Messung von

Strom und den Spannungen an allen Batteriezellen. Die dafür notwendige Synchronisierung erfordert ein spezialisiertes Funkprotokoll, das in der Software des Steuergerätes und der Sensoren zu realisieren ist. Die Anregung ist zu konzipieren. Exemplarische Messungen an LiFePo<sub>4</sub> Zellen sollen die Funktionsfähigkeit der implementierten Impedanzspektroskopie bestätigen. Eine Demonstration mit Anwendungsbezug soll möglich werden.

Die Aufgabenstellung umfasst die folgenden Punkte:

#### 1) **Einführung und Grundlagen**

- Prinzip der Zellen-Überwachung und des Batteriemangements
- Darstellung des aktuellen Standes der Vorarbeiten der Arbeitsgruppe
- Einführung in Grundlagen der elektrochemischen Impedanzspektroskopie
- Erfassen der auf den verschiedenen Sensorklassen verfügbaren Messauflösung, der Messraten und der speicherbedingt möglichen Blockgrößen

#### 2) **Analyse und Konzeption**

- Auswertung der vorhandenen Sensoren und Steuergeräte und des EIS-Laborgerätes
- Analyse der messtechnischen Anforderungen für die EIS (Messauflösung, Synchronisation, Frequenzbereich) und einer geeigneten Anregung
- Lösungserarbeitung bzgl. ADC-Auflösung und/oder Offsetkompensation
- Konzeption und Strukturierung eines Lösungsvorschlags

#### 3) **Neuentwicklung und Redesign der Hardware**

- Neuentwicklung eines Batteriesteuergerätes auf Basis eines ARM Cortex M4 Mikrocontrollers
- Entwicklung einer Transceiverplatine und einer Strommessplatine für das Batteriesteuergerät
- Erweiterung mit geeigneten ADC auf dem Zellsensor, ggf. mit einer analogen Vorverarbeitung
- Redesign / Erweiterung der vorhandenen Zellsensoren
- Entwurf, Aufbau und Inbetriebnahme der entwickelten Hardware

#### 4) **Software-Entwurf u. Implementierung für die Impedanzspektroskopie**

- Phasenrichtige Aufnahme von Strom und Zellspannungen im Batteriesteuergerät und in den Sensoren sowie der passend koordinierten Ansteuerung der Anregung
- Softwareentwicklung für das Batteriesteuergerät und Einbindung der Transceiver- und der Strommessplatine sowie des Rechenverfahrens des EIS
- Softwareerweiterung der Zellsensoren unter Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen des Controller

#### 4) **Erprobung und Funktionsnachweis**

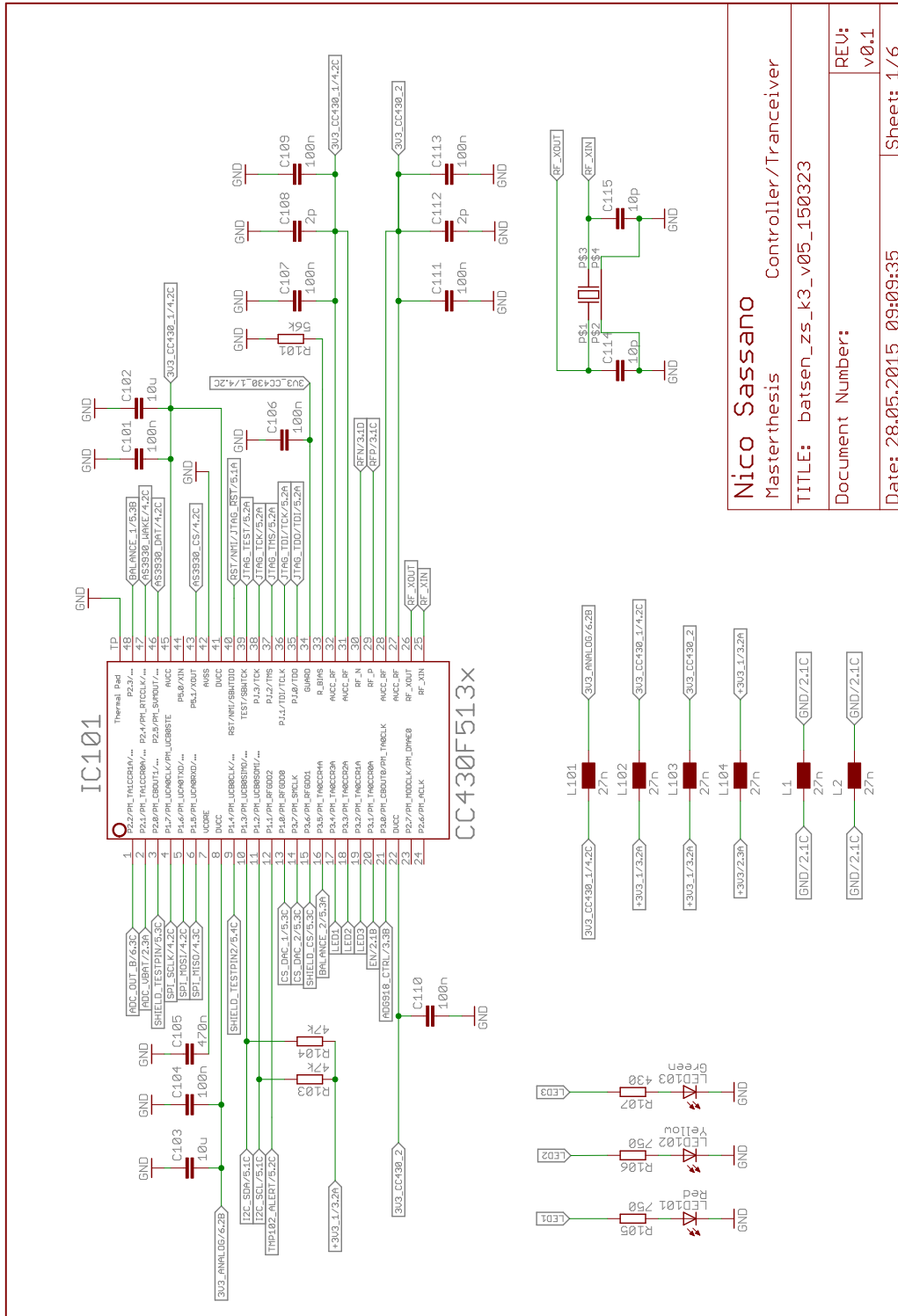
- Erstellen von EIS-Messreihen einer Batterie aus LiFePO<sub>4</sub>-Zellen über verschiedene SoC und Temperaturen
- Genauigkeits-, Rausch- und Jitteruntersuchungen

#### 5) **Auswertung und Bewertung der Ergebnisse**

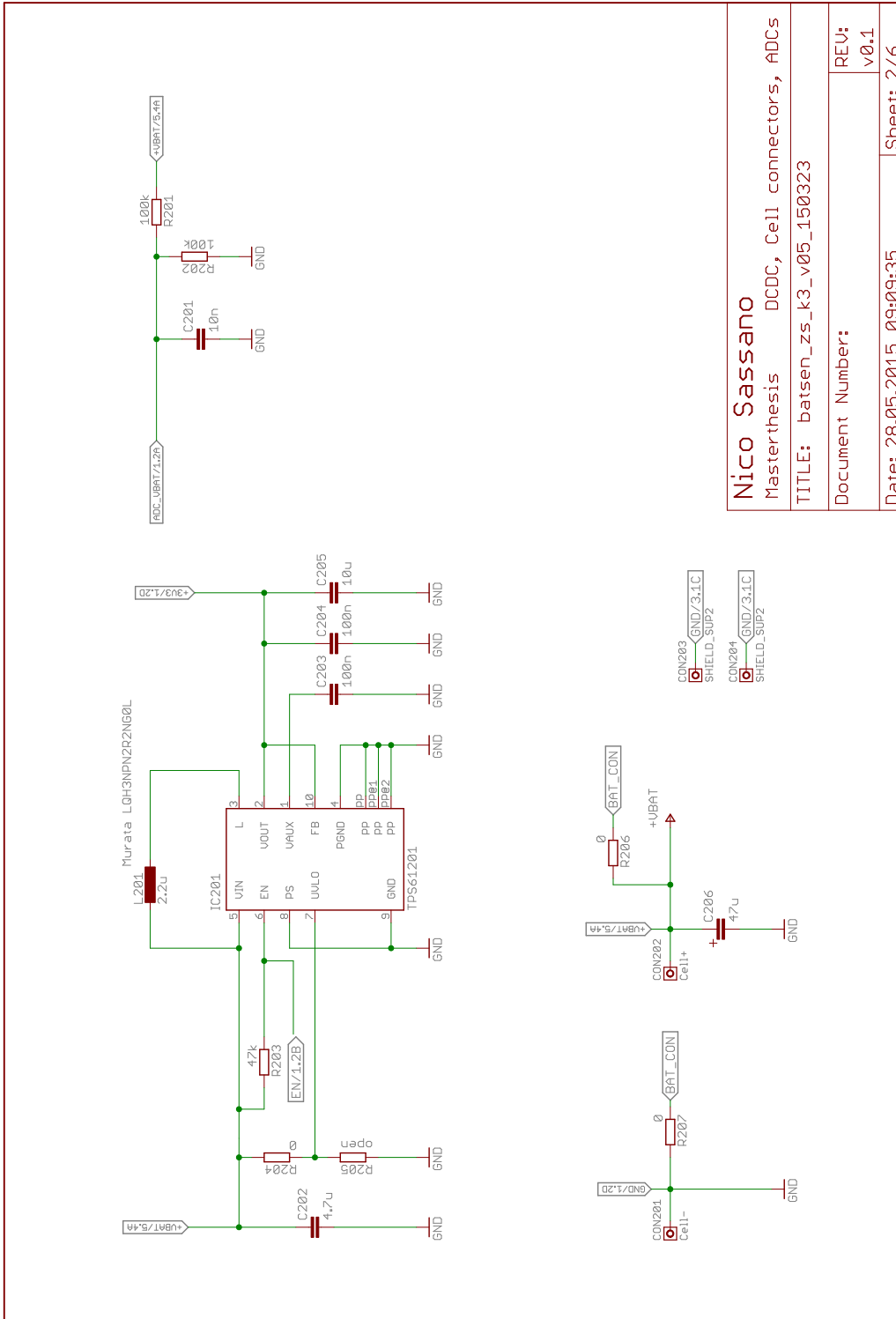
- Erstellen von EIS-Messreihen einer Batterie aus LiFePO<sub>4</sub> -Zellen über verschiedene SoC und Temperaturen
- Vergleich mit EIS-Messgeräten und der entwickelten Messmethode
- Bewertung im Hinblick auf die Aussagekraft für Batteriekennwerte
- Diskussion von Vor- und Nachteilen in Bezug auf die Anwendung

## **J. Schaltplan**

Schaltplan: Zellsensor



Nico Sassano  
Masterthesis  
TITLE: batsen\_zs\_k3\_v05\_150323  
Controller/Tranceiver  
Document Number:  
Date: 28.05.2015 09:09:35  
REU:  
v0.1  
Sheet: 1/6



Nico Sassano

Masterthesis DCDC, Cell connectors, ADCs

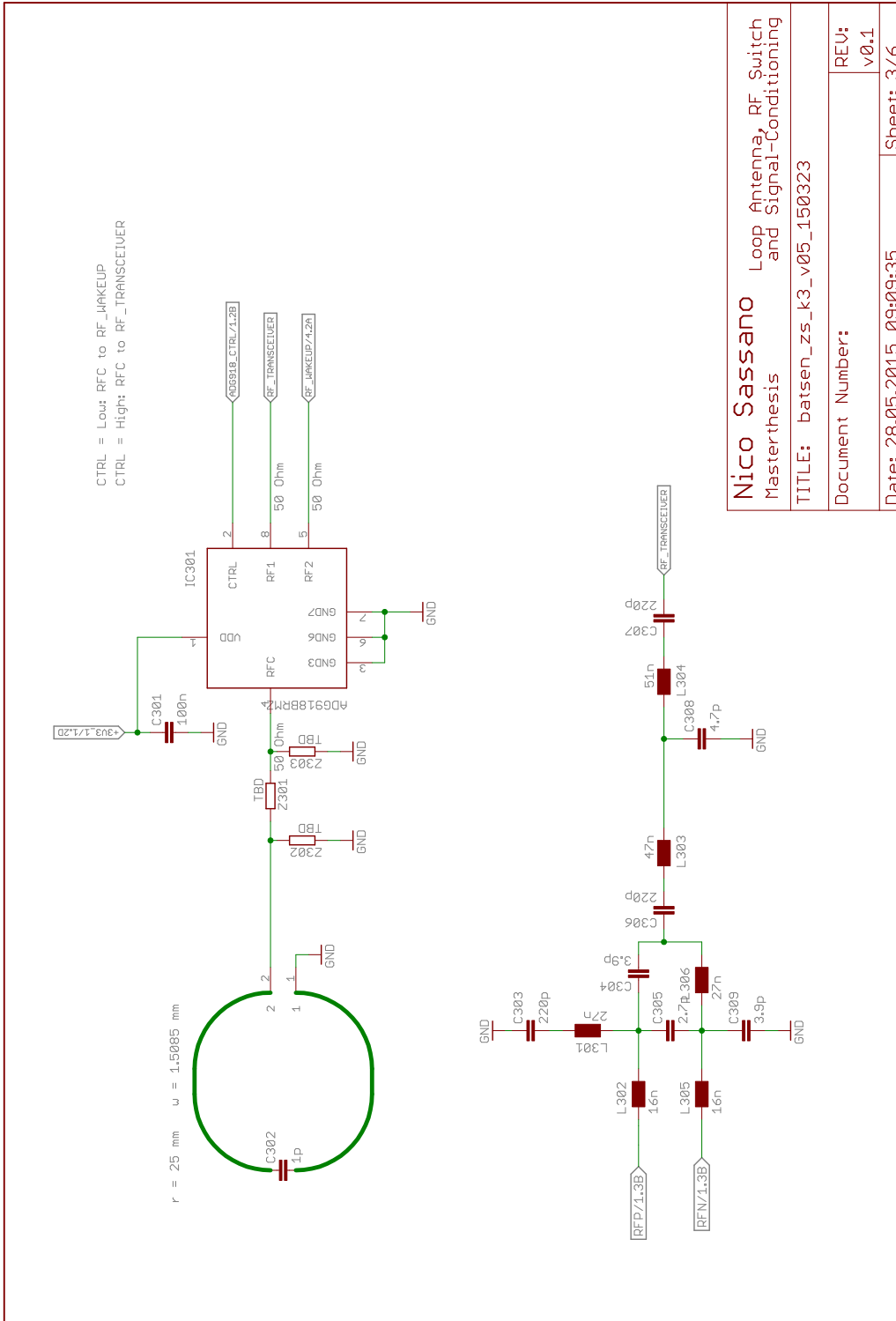
TITLE: batsen\_zs\_k3\_v05\_1150323

Document Number:

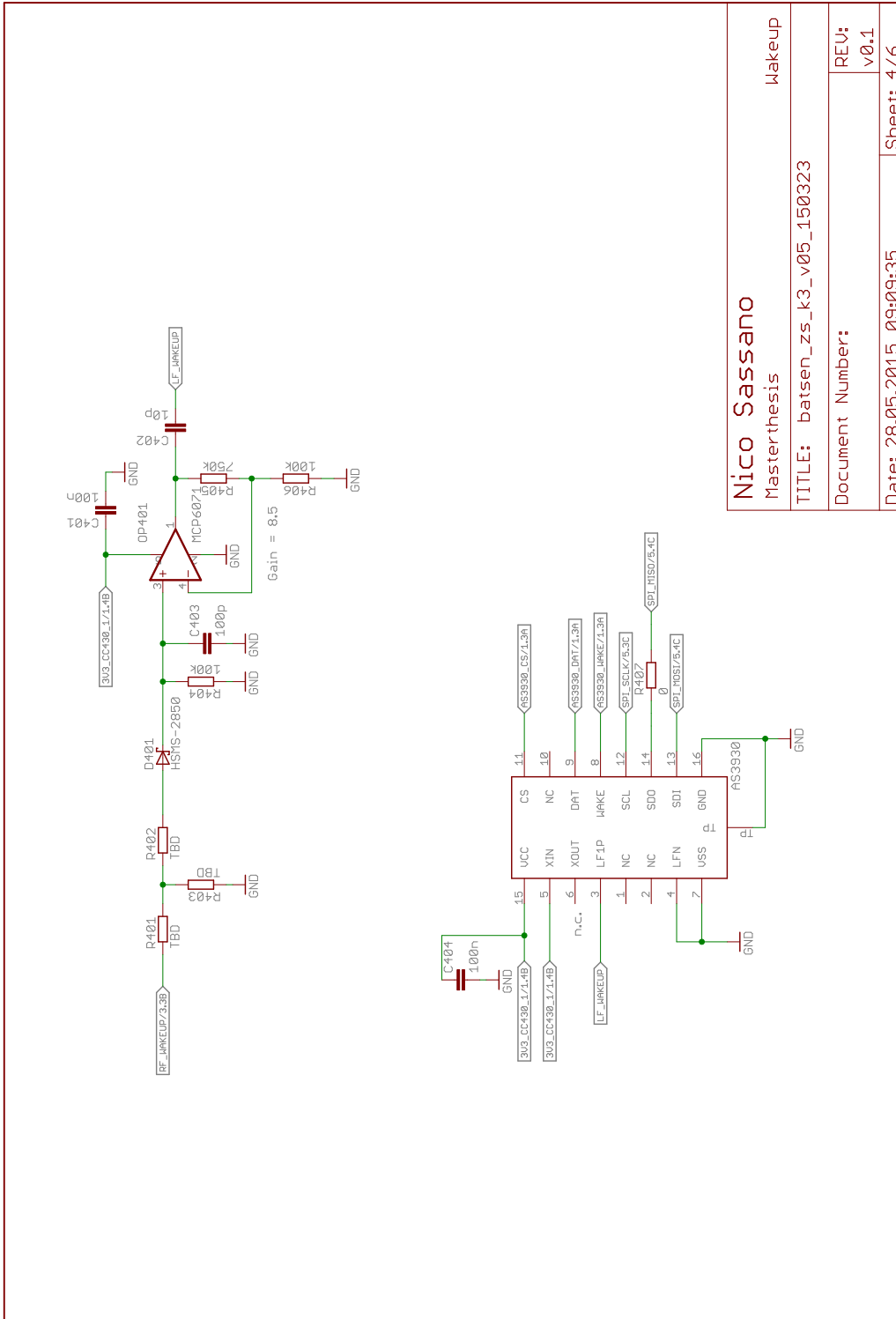
REV:  
v0.1

Date: 28.05.2015 09:09:35

Sheet: 2/6



**Nico Sassano**    Loop Antenna, RF Switch  
 Masterthesis        and Signal-Conditioning  
 TITLE:    batsen\_zs\_k3\_v05\_150323  
 Document Number:  
 Date: 28.05.2015 09:09:35    Sheet: 3/6  
 REV:    v0.1



Nico Sassano

Masterthesis

TITLE: batsen\_zs\_k3\_v05\_150323

Document Number:

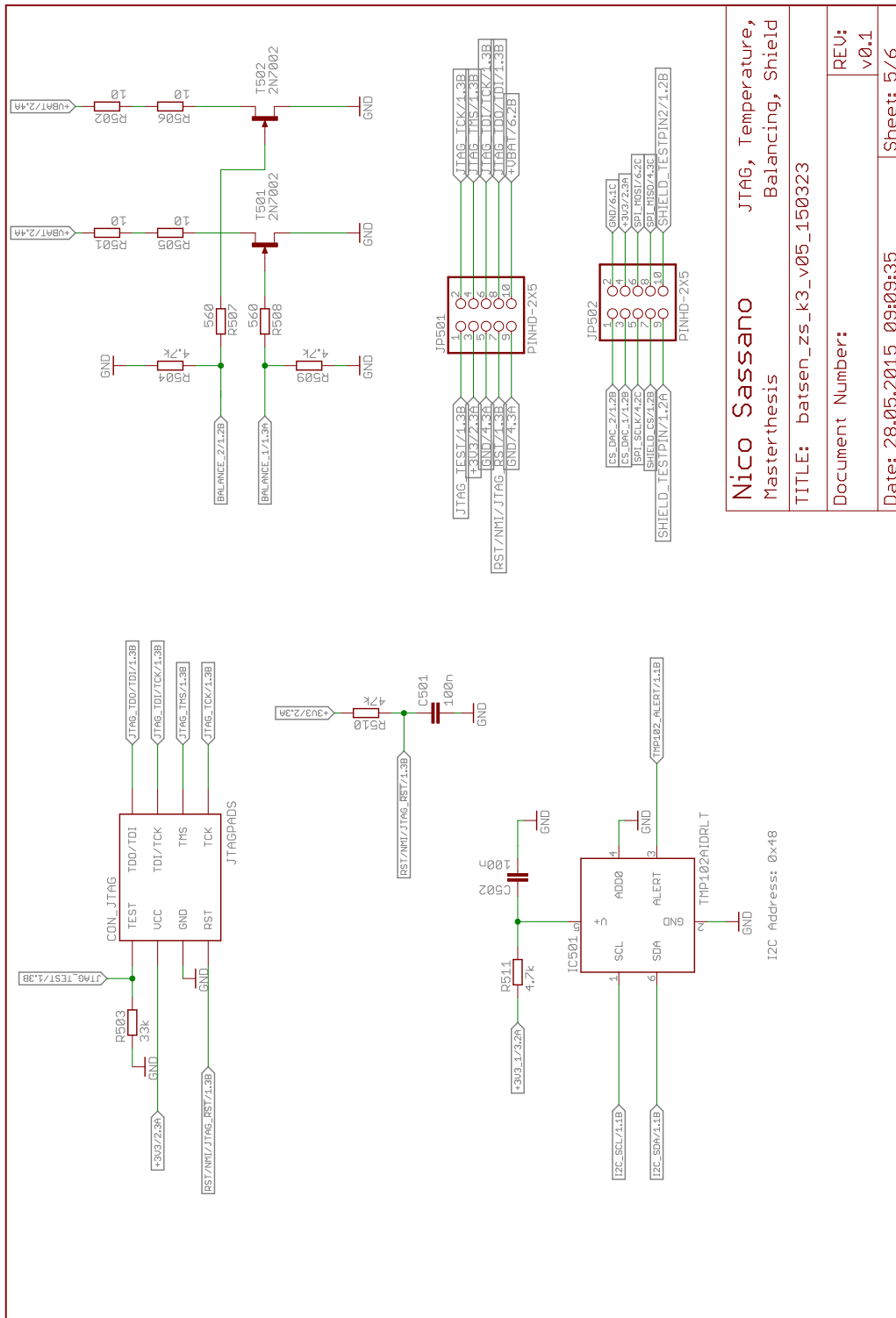
Date: 28.05.2015 09:09:35

Sheet: 4/6

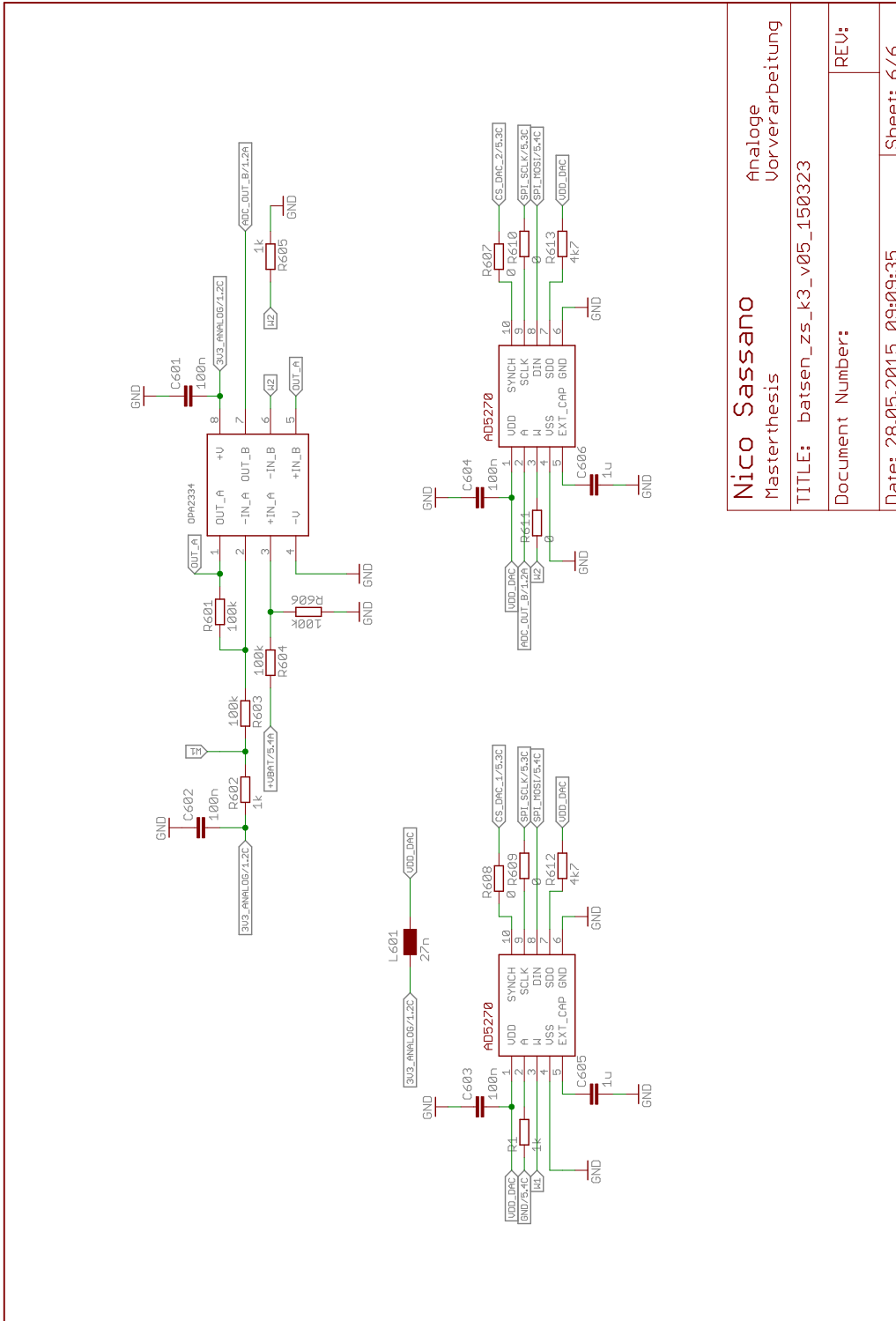
WakeUp

REV:  
v0.1





Nico Sassano  
 Masterthesis  
 JTAG, Temperature, Balancing, Shield  
 TITLE: batsen\_zs\_k3\_v05\_150323  
 Document Number:  
 Date: 28.05.2015 09:09:35  
 REV: v0.1  
 Sheet: 5/6



Nico Sassano

Analoge  
Vorverarbeitung

Masterthesis

TITLE: batsen\_zs\_k3\_v05\_1150323

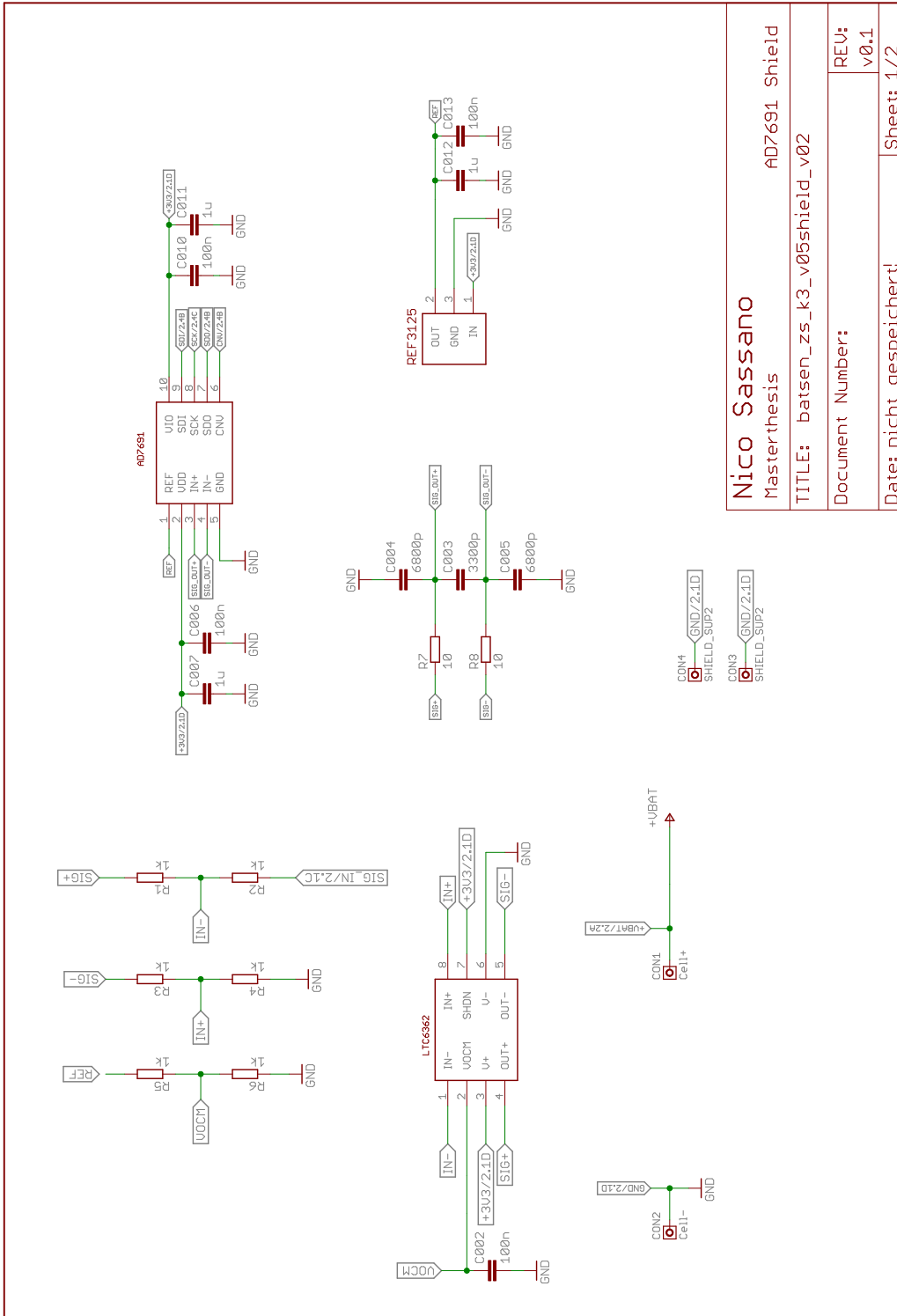
Document Number:

REV:

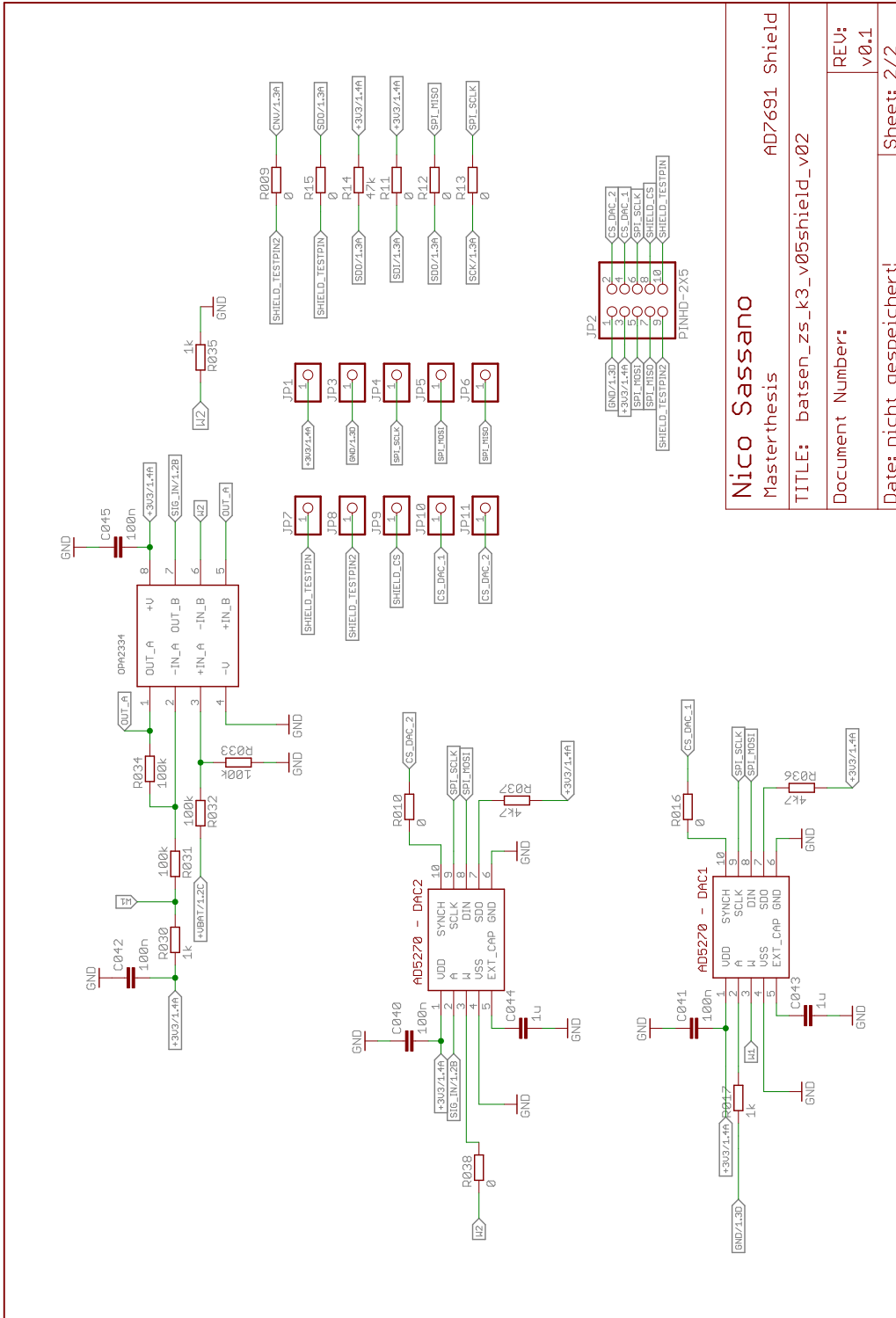
Date: 28.05.2015 09:09:35

Sheet: 6/6

Schaltplan: Hochauflösende AD-Wandler Erweiterungsplatine



Nico Sassano	
Masterthesis	
AD7691 Shield	
TITLE: batsen_zs_k3_v05shield_v02	
Document Number:	REV: v0.1
Date: nicht gespeichert!	Sheet: 1/2



Nico Sassano  
 Masterthesis

AD7691 Shield

TITLE: batsen\_zs\_k3\_v05shield\_v02

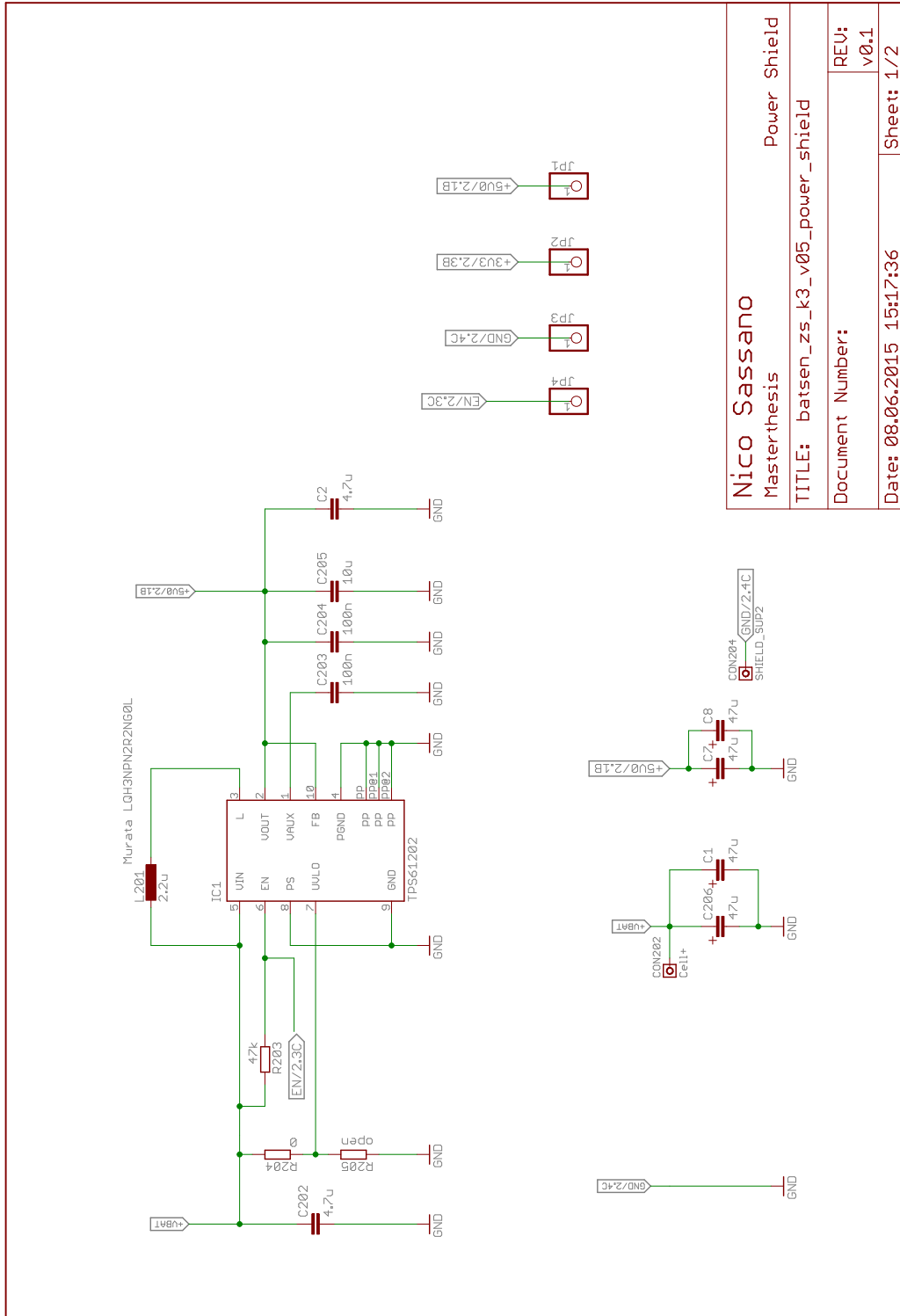
Document Number:

REV:  
 v0.1

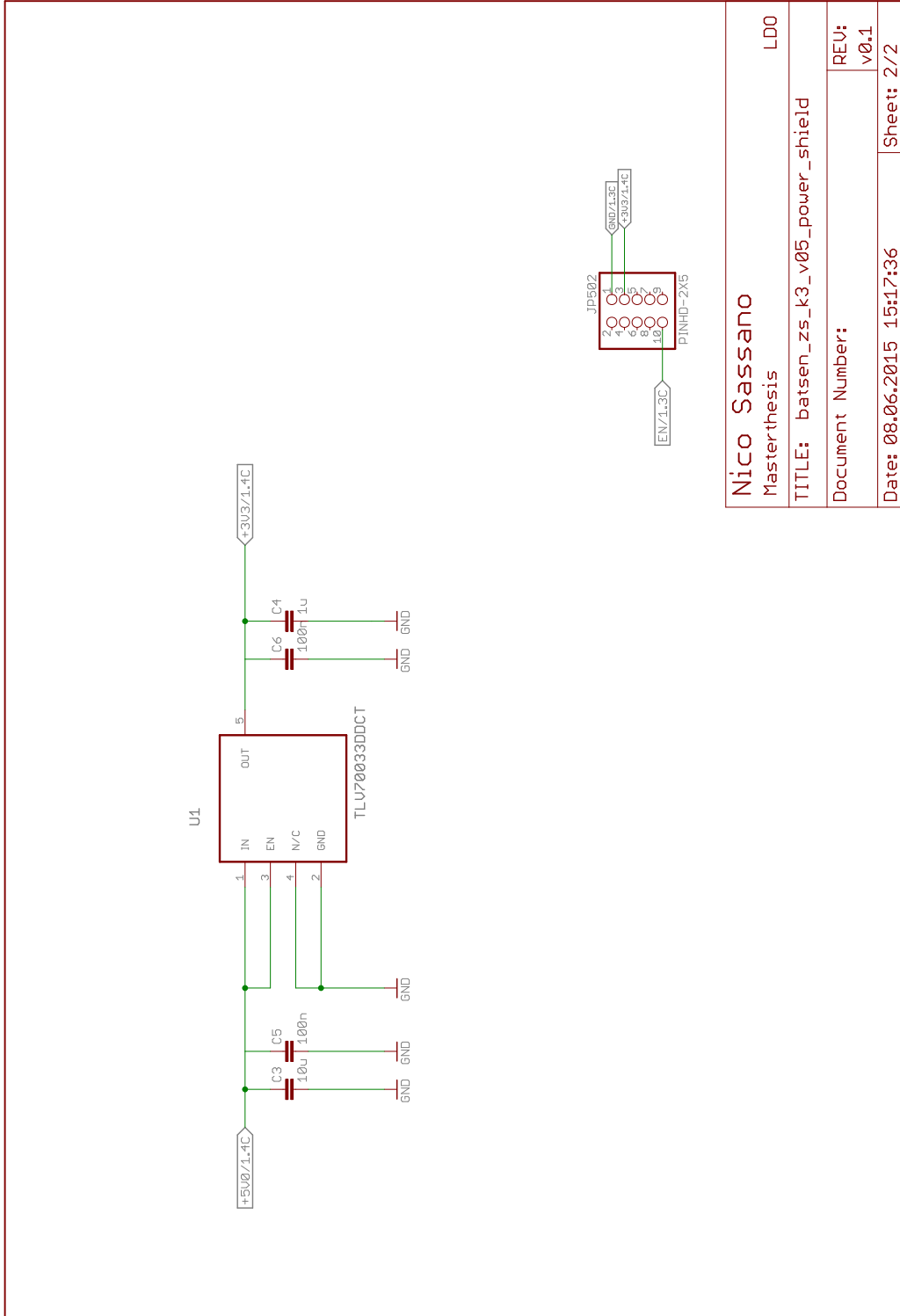
Date: nicht gespeichert!

Sheet: 2/2

Schaltplan: Spannungsversorgungs-Erweiterungsplatine

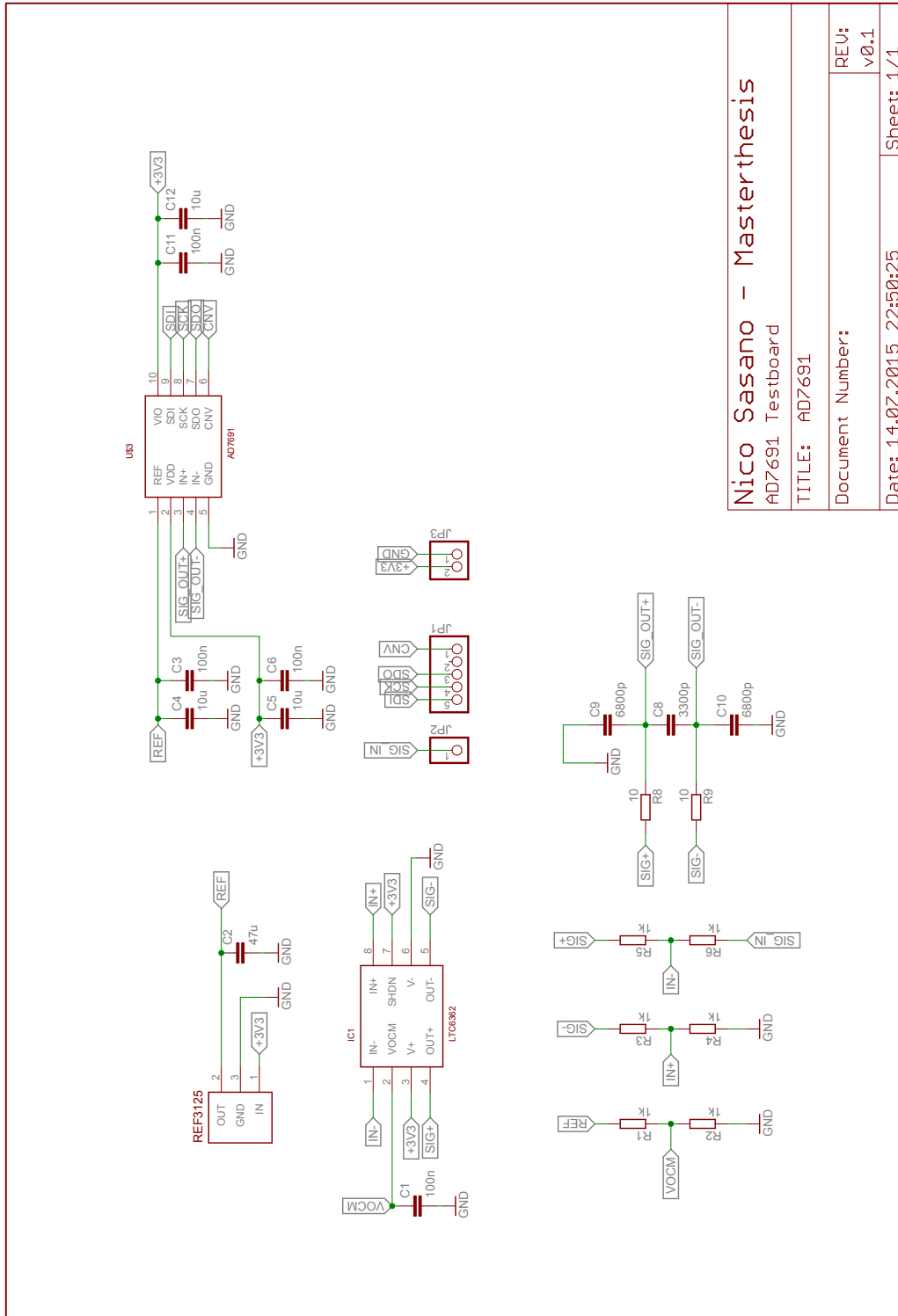


Nico Sassano		Power Shield
Masterthesis		
TITLE: batsen_zs_k3_v05_power_shield		
Document Number:		REV: v0.1
Date: 08.06.2015 15:17:36		Sheet: 1/2



Nico Sassano	LDO
Masterthesis	
TITLE: batsen_zs_k3_v05_power_shield	
Document Number:	REU: v0.1
Date: 08.06.2015 15:17:36	Sheet: 2/2

Schaltplan: AD7691 Testplatine



Nico Sasano - Masterthesis

AD7691 Testboard

TITLE: AD7691

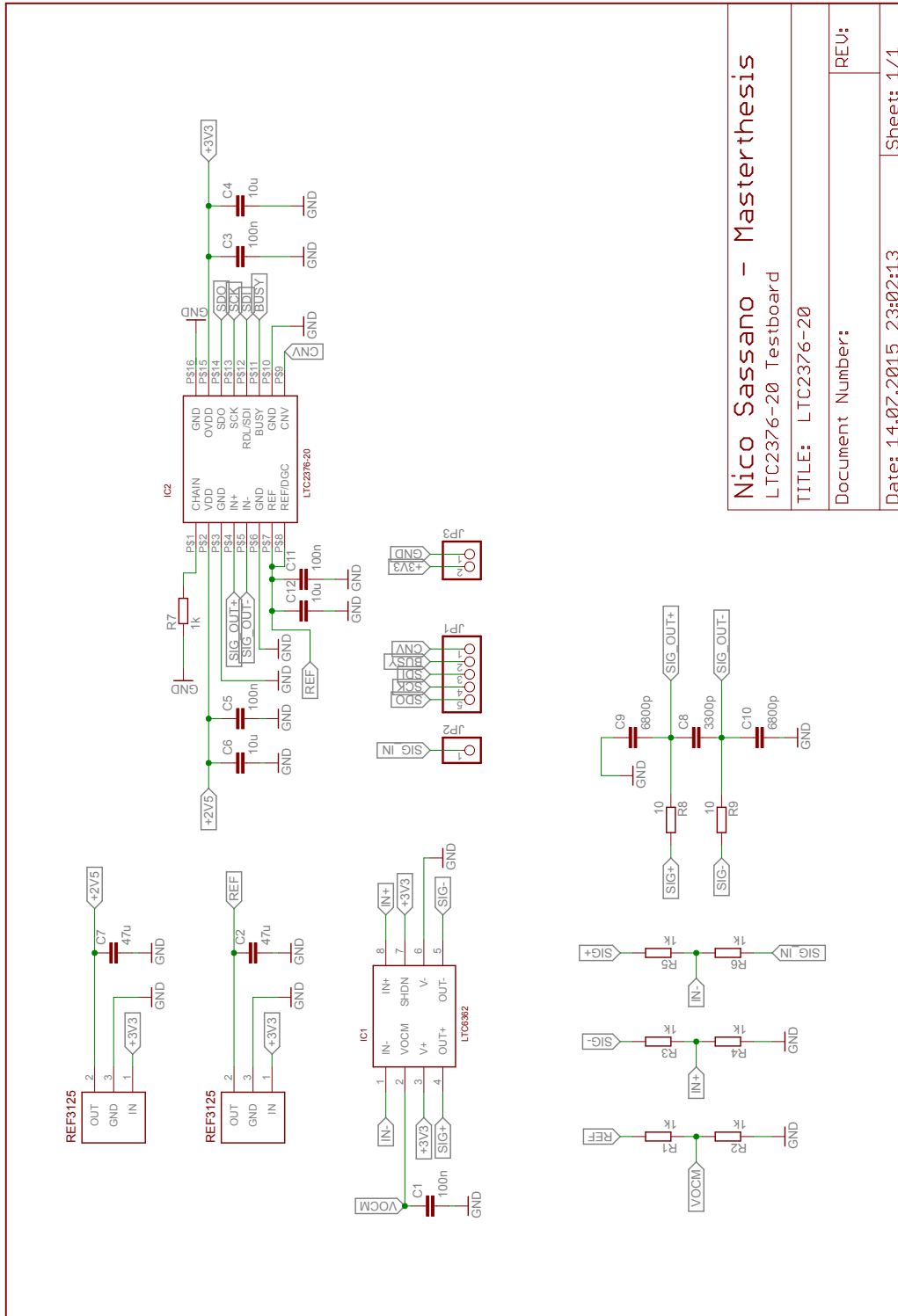
Document Number:

REU:  
v0.1

Date: 14.07.2015 22:50:25

Sheet: 1/1

Schaltplan: LTC2376-20 Testplatine



Nico Sassano - Masterthesis

LTC2376-20 Testboard

TITLE: LTC2376-20

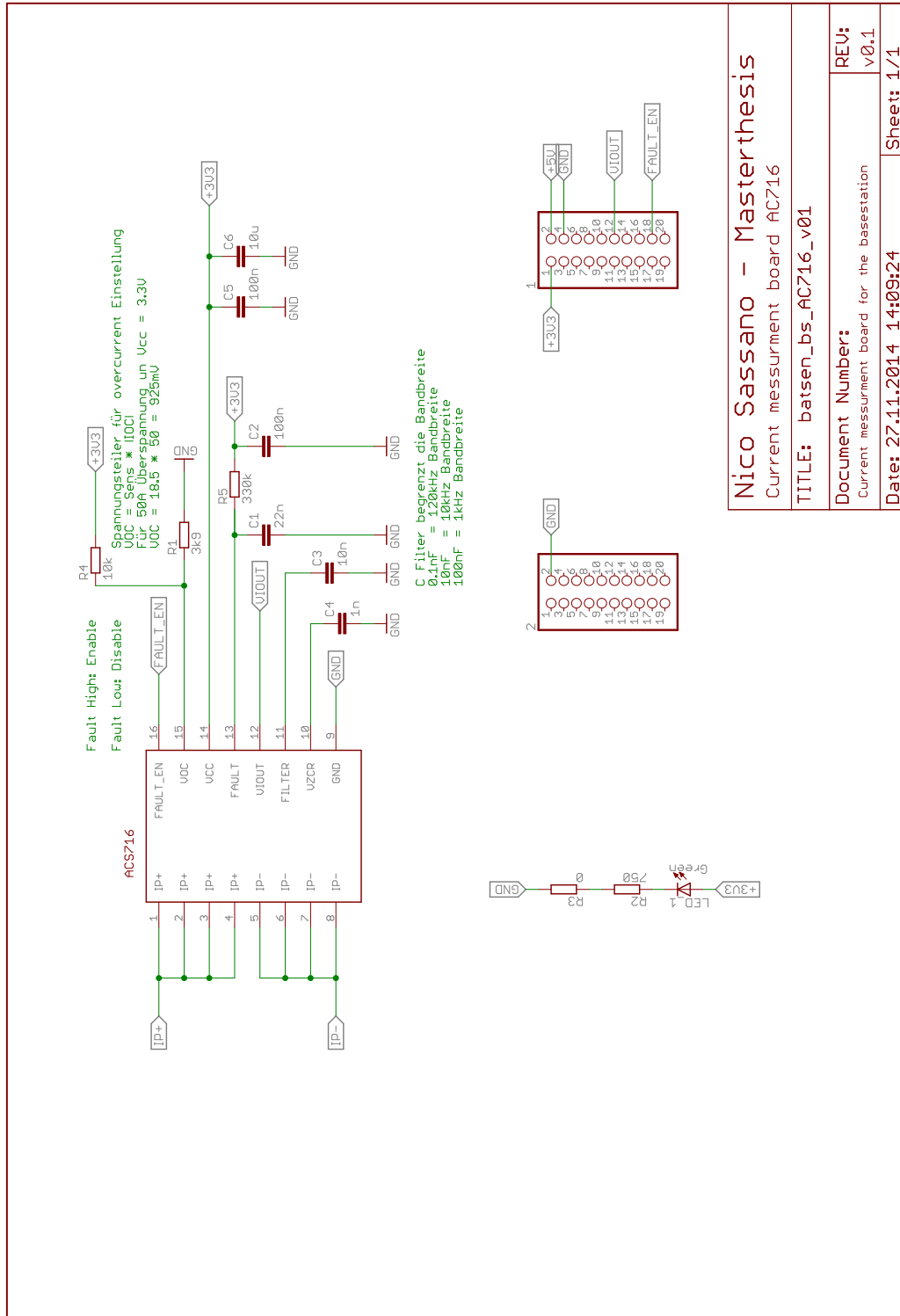
Document Number: REV:

Date: 14.07.2015 23:02:13

Sheet: 1/1

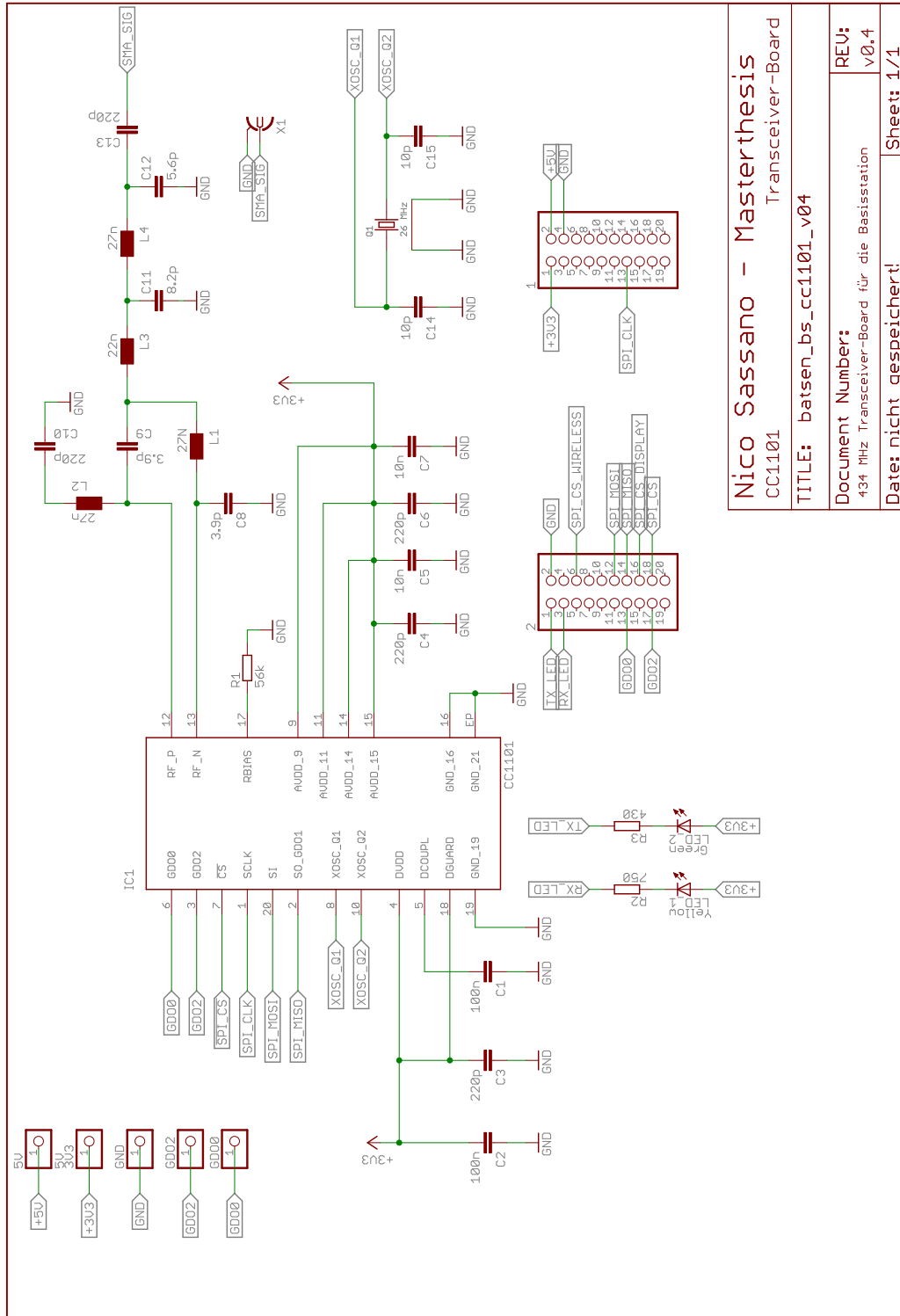


Schaltplan: ACS716 Strommess-Erweiterungsplatine



**Nico Sassano - Masterthesis**  
 Current measurement board ACS716  
 TITLE: batsen\_bs\_ACS716\_v01  
 Document Number:  
 Current measurement board for the basestation  
 Date: 27.1.2014 14:09:24  
 REV: v0.1  
 Sheet: 1/1

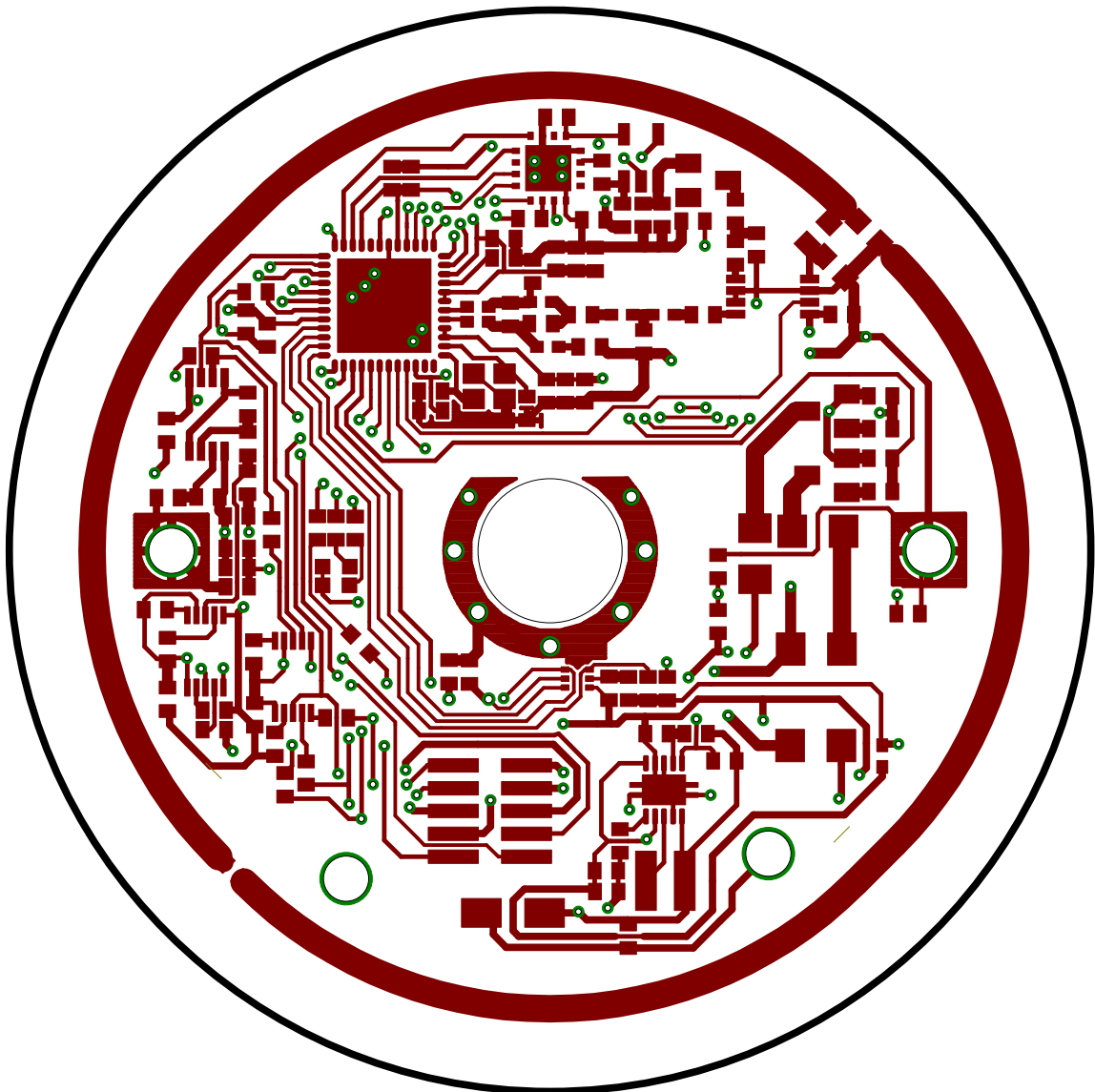
Schaltplan: CC1101 Transceiver-Erweiterungsplatine

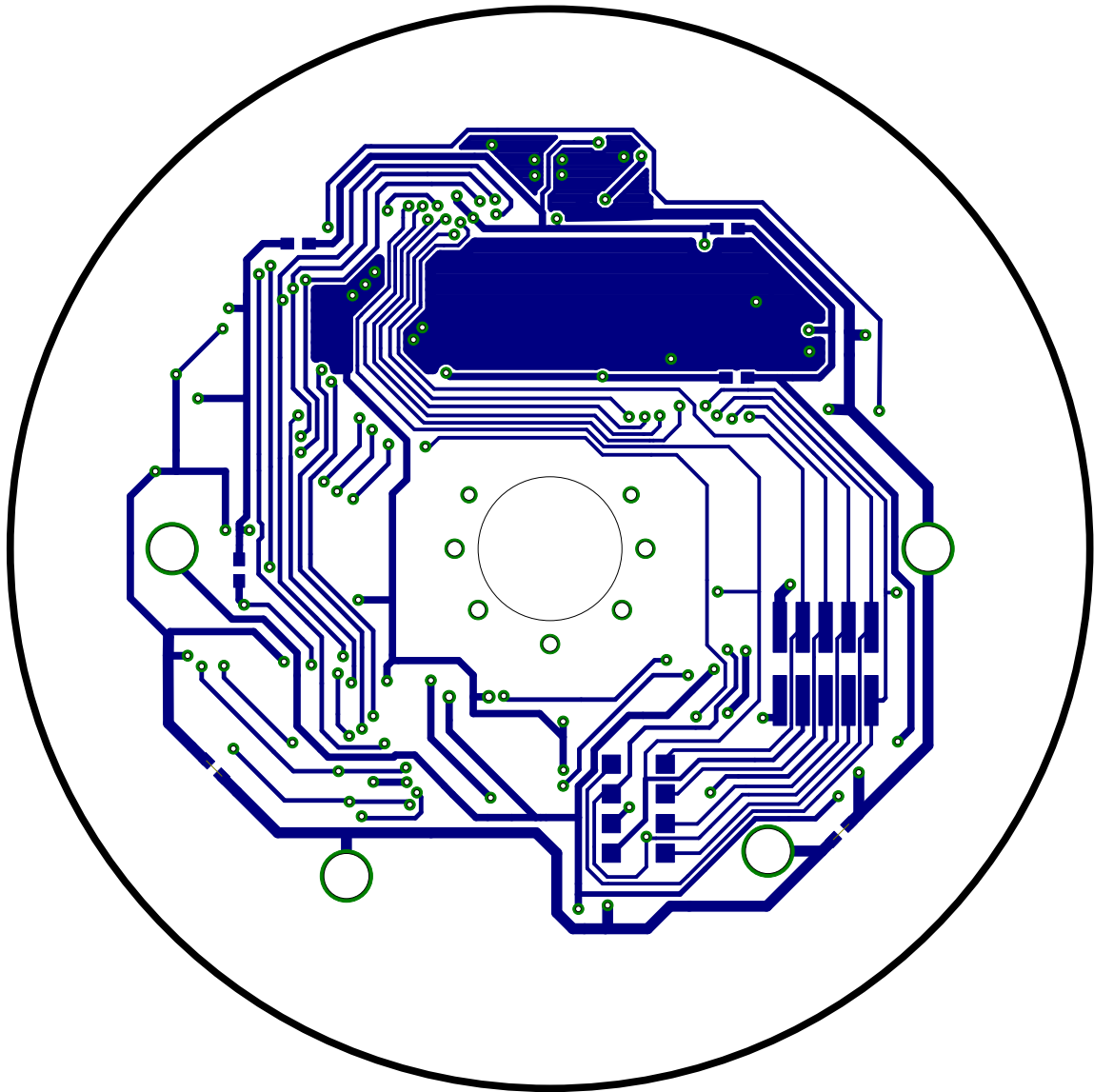


Nico Sassano - Masterthesis  
 Transceiver-Board  
 CC1101  
 TITLE: batsen\_bs\_cc1101\_v04  
 Document Number:  
 434 MHz Transceiver-Board für die Basisstation  
 REV: v0.4  
 Date: nicht gespeichert!  
 Sheet: 1/1

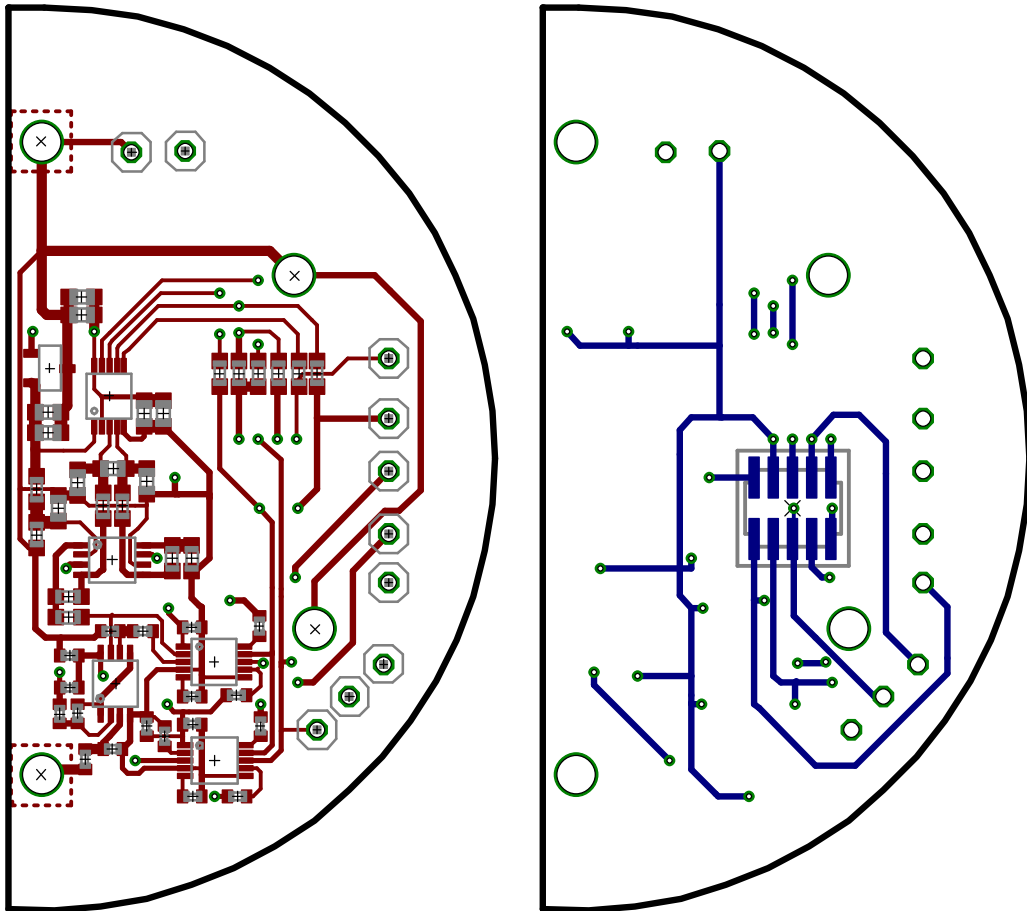
# K. Platinenlayout

Layout: Zellsensor

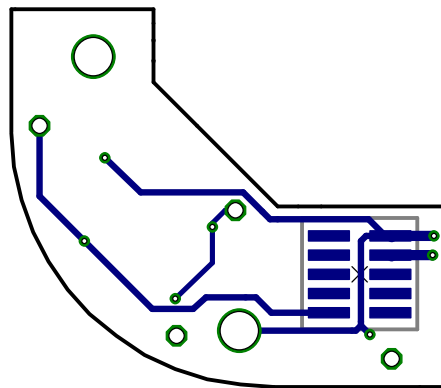
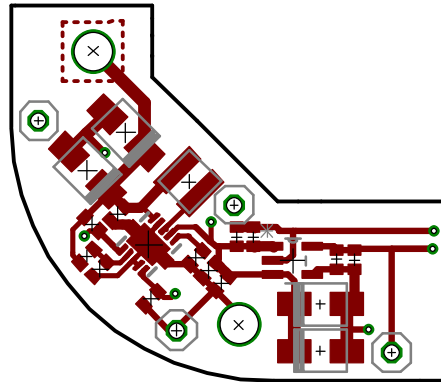




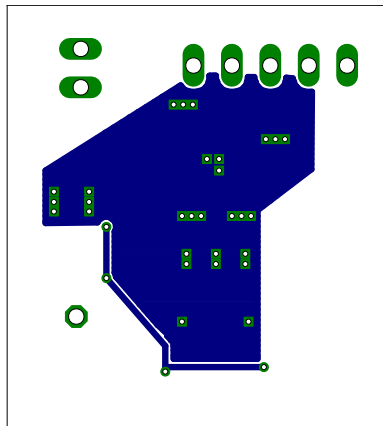
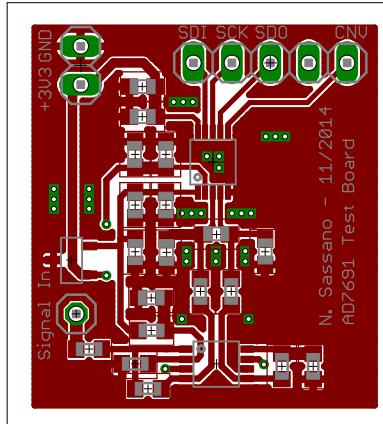
**Layout: Hochauflösende AD-Wandler Erweiterungsplatine**



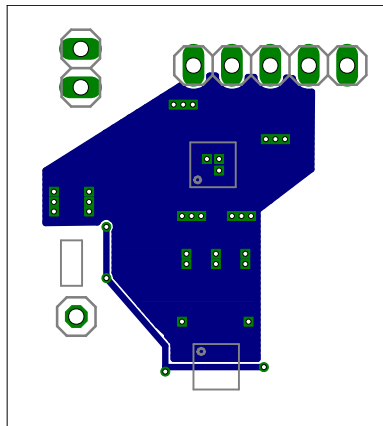
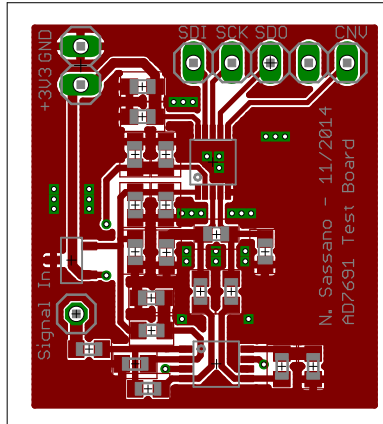
**Layout: Spannungsversorgungs-Erweiterungsplatine**



**Layout: AD7691 Testplatine**

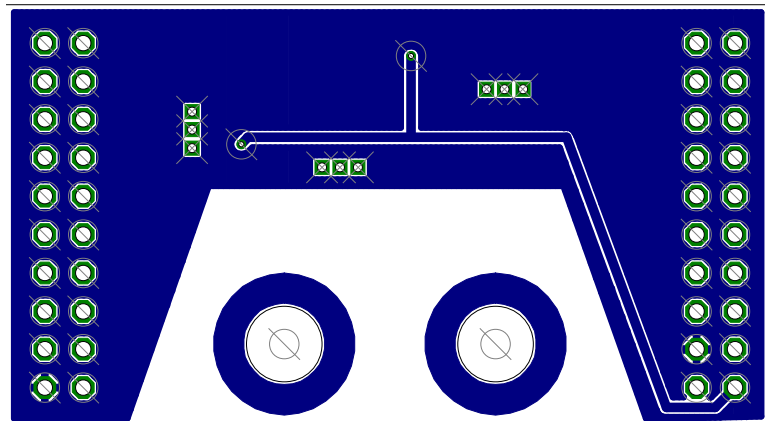
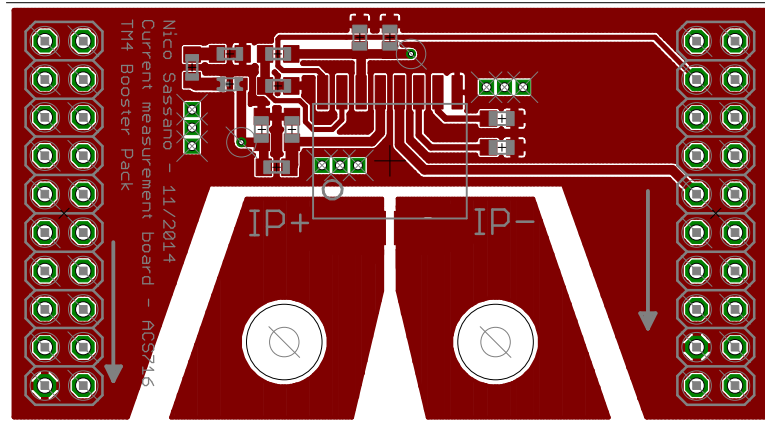


**Layout: LTC2376-20 Testplatine**

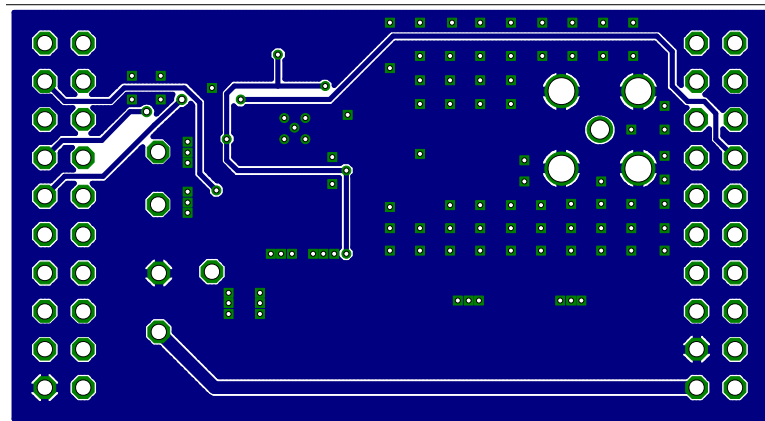
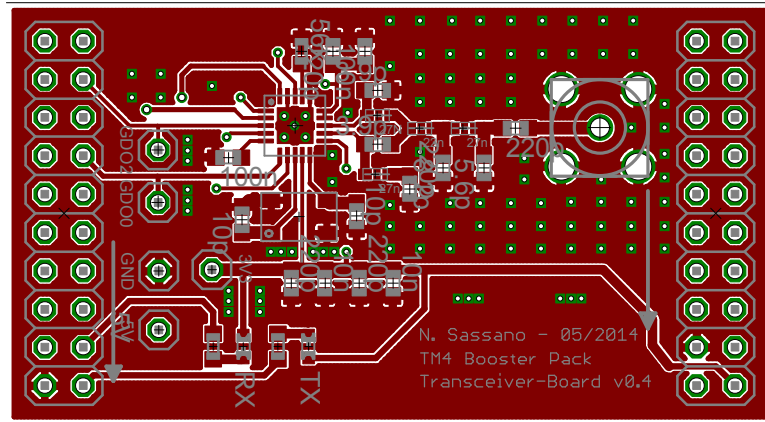




**Layout: ACS716 Strommess-Erweiterungsplatine**



Layout: CC1101 Transceiver-Erweiterungsplatine



## **L. Quellcode des Messsystem in C**

# Listings

Quellcode/GoertzelTestprogramm/goertzel_test.cpp . . . . .	211
Quellcode/BS/AD5270.c . . . . .	242
Quellcode/BS/AD7176.c . . . . .	244
Quellcode/BS/AD7691.c . . . . .	247
Quellcode/BS/adc.c . . . . .	250
Quellcode/BS/CC1101.c . . . . .	251
Quellcode/BS/convert.c . . . . .	274
Quellcode/BS/gpio.c . . . . .	279
Quellcode/BS/interrupts.c . . . . .	281
Quellcode/BS/LTC2376.c . . . . .	289
Quellcode/BS/main.c . . . . .	293
Quellcode/BS/spi.c . . . . .	312
Quellcode/BS/timer.c . . . . .	313
Quellcode/BS/uart.c . . . . .	316
Quellcode/BS/uart_check.c . . . . .	317
Quellcode/BS/HeaderBS/AD5270.h . . . . .	319
Quellcode/BS/HeaderBS/AD7176.h . . . . .	319
Quellcode/BS/HeaderBS/AD7691.h . . . . .	320
Quellcode/BS/HeaderBS/adc.h . . . . .	320
Quellcode/BS/HeaderBS/CC1101.h . . . . .	321
Quellcode/BS/HeaderBS/convert.h . . . . .	325
Quellcode/BS/HeaderBS/gpio.h . . . . .	325
Quellcode/BS/HeaderBS/interrupts.h . . . . .	326
Quellcode/BS/HeaderBS/LTC2376.h . . . . .	326
Quellcode/BS/HeaderBS/main.h . . . . .	326
Quellcode/BS/HeaderBS/spi.h . . . . .	327
Quellcode/BS/HeaderBS/convert.h . . . . .	327
Quellcode/BS/HeaderBS/uart.h . . . . .	327
Quellcode/BS/HeaderBS/uart_check.h . . . . .	327
Quellcode/ZS/AD5270.c . . . . .	328
Quellcode/ZS/AD7691.c . . . . .	330
Quellcode/ZS/adc12.c . . . . .	331
Quellcode/ZS/adg918.c . . . . .	333

---

Quellcode/ZS/as3930.c . . . . .	334
Quellcode/ZS/balancing.c . . . . .	336
Quellcode/ZS/cc430.c . . . . .	337
Quellcode/ZS/clk.c . . . . .	344
Quellcode/ZS/delay.c . . . . .	346
Quellcode/ZS/i2c.c . . . . .	347
Quellcode/ZS/init.c . . . . .	349
Quellcode/ZS/isr.c . . . . .	351
Quellcode/ZS/led.c . . . . .	364
Quellcode/ZS/main.c . . . . .	365
Quellcode/ZS/spi.c . . . . .	380
Quellcode/ZS/temp_sensor.c . . . . .	381
Quellcode/ZS/timer.c . . . . .	383
Quellcode/ZS/Header/AD5270.h . . . . .	392
Quellcode/ZS/Header/adc12.h . . . . .	392
Quellcode/ZS/Header/adg918.h . . . . .	395
Quellcode/ZS/Header/as3930.h . . . . .	395
Quellcode/ZS/Header/balancing.h . . . . .	396
Quellcode/ZS/Header/cc430.h . . . . .	396
Quellcode/ZS/Header/clk.h . . . . .	398
Quellcode/ZS/Header/delay.h . . . . .	398
Quellcode/ZS/Header/i2c.h . . . . .	399
Quellcode/ZS/Header/init.h . . . . .	399
Quellcode/ZS/Header/led.h . . . . .	399
Quellcode/ZS/Header/main.h . . . . .	400
Quellcode/ZS/Header/spi.h . . . . .	404
Quellcode/ZS/Header/temp_sensor.h . . . . .	405
Quellcode/ZS/Header/timer.h . . . . .	406
Quellcode/ZS/Header/types.h . . . . .	408
Quellcode/Matlab/EISMessung_Arbeit.m . . . . .	409

```
1  /*****
2  **   File name       : AD5270.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 11/02/2015
5  **   Last Update     : 17/07/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : A5270
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/main.h"
28 #include "header/uart.h"
29 #include "header/spi.h"
30 #include "header/timer.h"
31 #include "header/interrupts.h"
32 #include "header/CC1101.h"
33 #include "header/gpio.h"
34 #include "header/convert.h"
35 #include "header/uart_check.h"
36 #include "header/adc.h"
37 #include "header/AD5270.h"
38
39 //*****
40 // This function is set the AD5270 DAC
41 // at the first OPA344 OP AMP
42 //*****
43 void write_AD5270_1(uint16_t res_value) {
44     uint16_t value = 0;
45     uint8_t upper_byte = 0;
46     uint8_t lower_byte = 0;
47
48     value = AD5270_WRITE_CMD | res_value;
49
50     upper_byte = (value >> 8);
51     lower_byte = (value >> 0);
52
53     AD5270_CS1_OUTPUT;
54
55     AD5270_CS1_ENABLE;
56
57     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, 0x1C);
58
59     // Wait untill SSI3 is ready
60     while(SSIBusy(SSI3_BASE));
61
62     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, 0x03);
63
64     // Wait untill SSI3 is ready
65     while(SSIBusy(SSI3_BASE));
66
67     AD5270_CS1_DISABLE;
68
69     delay_ms(1);
70     AD5270_CS1_ENABLE;
71
72     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, upper_byte);
73
74     // Wait untill SSI3 is ready
75     while(SSIBusy(SSI3_BASE));
76
77     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, lower_byte);
78
79     // Wait untill SSI3 is ready
80     while(SSIBusy(SSI3_BASE));
81
82     AD5270_CS1_DISABLE;
83 }
84
85 //*****
```

```

86 // This function is set the AD5270 DAC
87 // at the second OPA344 OP AMP
88 //*****
89 void write_AD5270_2(uint16_t res_value) {
90     uint16_t value = 0;
91     uint8_t upper_byte = 0;
92     uint8_t lower_byte = 0;
93
94     value = AD5270_WRITE_CMD | res_value;
95
96     upper_byte = (value >> 8);
97     lower_byte = (value >> 0);
98
99     AD5270_CS2_OUTPUT;
100
101     AD5270_CS2_ENABLE;
102
103     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, 0x1C);
104
105     // Wait untill SSI3 is ready
106     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
107
108     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, 0x03);
109
110     // Wait untill SSI3 is ready
111     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
112
113     AD5270_CS2_DISABLE;
114
115     delay_ms(2);
116     AD5270_CS2_ENABLE;
117
118     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, upper_byte);
119
120     // Wait untill SSI3 is ready
121     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
122
123     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, lower_byte);
124
125     // Wait untill SSI3 is ready
126     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
127
128     AD5270_CS2_DISABLE;
129 }
130
131 //*****
132 // This function set the output voltage
133 // after the first OPA344 OP AMP
134 //*****
135 void ctr_voltage_AD5270(uint16_t final_voltage) {
136     uint16_t value_DAC = 0x000; // first value
137     uint16_t value_ADC = 0xFFF;
138     uint32_t pui32ADC0Value[1];
139
140     while(final_voltage < (value_ADC + 100)){
141         value_DAC = value_DAC + 10;
142         write_AD5270_1(value_DAC);
143         //*****
144         // !!!! ADC Wandlung ink. Abspeicherung dauert 3,2us !!!!!!!
145         // ADC hat eine Referenzspannung von 3.3V
146         // Start the current messurment
147         ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3); // Trigger the ADC conversion.
148         while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false)); // Wait for conversion to be completed
149         ADCIntClear(ADC0_BASE, 3); // Clear the ADC interrupt flag.
150         ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 3, pui32ADC0Value); // Read ADC Value.
151         value_ADC = pui32ADC0Value[0];
152         //*****
153     };
154 }

```

```

1  /*****
2  **   File name       : AD5270.c
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 14/01/2015
5  **   Last Update    : 17/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : AD7176
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/main.h"
28 #include "header/uart.h"
29 #include "header/spi.h"
30 #include "header/timer.h"
31 #include "header/interrupts.h"
32 #include "header/CC1101.h"
33 #include "header/gpio.h"
34 #include "header/convert.h"
35 #include "header/uart_check.h"
36 #include "header/adc.h"
37 #include "header/AD7176.h"
38
39 extern uint32_t matlab_mode;
40
41 /*****
42 // AD7176 Test mode
43 // Data declaration for thesting AD7176
44 // This can be deleted after testing the ADC
45 *****/
46 extern volatile uint8_t AD7176_index;
47 extern volatile uint8_t AD7176_count;
48 extern volatile uint32_t AD7176_data[2]; // 24-bit data storage
49 extern volatile uint32_t AD7176_asynch_counter;
50 extern volatile uint32_t AD7176_values;
51 extern volatile uint32_t AD7176_frequency_time;
52 extern volatile uint32_t AD7176_value;
53 extern volatile uint32_t AD7176_value_storage[2000];
54
55 /*****
56 // This function is config the AD7176 ADC
57 *****/
58 void init_AD7176(void) {
59
60     // BUSY Input Pin
61     AD7176_BUSY_SET_INPUT;
62     AD7176_IRQ_FALLING_EDGE;
63     AD7176_IRQ_DISABLE;
64
65     // CS LTC2376 Output Pin
66     AD7176_CS_SET_OUTPUT;
67     AD7176_CS_DISABLE;
68
69 }
70
71 /*****
72 // This function starts the sampling mode
73 *****/
74 void AD7176_start(uint8_t AD7176_frequency, uint8_t burst_values) {
75     uint32_t index = 0;
76
77     uint32_t value_high = 0;
78     uint32_t value_low = 0;
79
80     switch(burst_values) {
81         case BURST_VALUES_50:
82             AD7176_values = 50; break;
83
84         case BURST_VALUES_100:
85             AD7176_values = 100; break;

```



```
86
87     case BURST_VALUES_150:
88         AD7176_values = 150; break;
89
90     case BURST_VALUES_200:
91         AD7176_values = 200; break;
92
93     case BURST_VALUES_250:
94         AD7176_values = 250; break;
95
96     case BURST_VALUES_300:
97         AD7176_values = 300; break;
98
99     case BURST_VALUES_350:
100        AD7176_values = 350; break;
101
102     case BURST_VALUES_400:
103        AD7176_values = 400; break;
104
105     case BURST_VALUES_450:
106        AD7176_values = 450; break;
107
108     case BURST_VALUES_500:
109        AD7176_values = 500; break;
110
111     case BURST_VALUES_550:
112        AD7176_values = 550; break;
113
114     case BURST_VALUES_600:
115        AD7176_values = 600; break;
116
117     case BURST_VALUES_650:
118        AD7176_values = 650; break;
119
120     case BURST_VALUES_700:
121        AD7176_values = 700; break;
122
123     case BURST_VALUES_750:
124        AD7176_values = 750; break;
125
126     case BURST_VALUES_800:
127        AD7176_values = 800; break;
128
129     case BURST_VALUES_850:
130        AD7176_values = 850; break;
131
132     case BURST_VALUES_900:
133        AD7176_values = 900; break;
134
135     case BURST_VALUES_1000:
136        AD7176_values = 1000; break;
137
138     case BURST_VALUES_1500:
139        AD7176_values = 1500; break;
140
141     case BURST_VALUES_1900:
142        AD7176_values = 30000; break;
143 }
144
145 // To calculate the frequency_time
146 // (1/(frequency [Hz]*10^-6))
147 switch(AD7176_frequency) {
148     case BURST_FREQ_50HZ:
149         AD7176_frequency_time = 20000; break;
150
151     case BURST_FREQ_100HZ:
152         AD7176_frequency_time = 4000000;break;//10000; break;
153
154     case BURST_FREQ_150HZ:
155         AD7176_frequency_time = 6666; break;
156
157     case BURST_FREQ_200HZ:
158         AD7176_frequency_time = 5000; break;
159
160     case BURST_FREQ_250HZ:
161         AD7176_frequency_time = 4000; break;
162
163     case BURST_FREQ_300HZ:
164         AD7176_frequency_time = 3333; break;
165
166     case BURST_FREQ_350HZ:
167         AD7176_frequency_time = 2857; break;
168
169     case BURST_FREQ_400HZ:
170         AD7176_frequency_time = 2500; break;
```

```
171
172     case BURST_FREQ_450HZ:
173         AD7176_frequency_time = 2222; break;
174
175     case BURST_FREQ_500HZ:
176         AD7176_frequency_time = 2000; break;
177
178     case BURST_FREQ_550HZ:
179         AD7176_frequency_time = 1818; break;
180
181     case BURST_FREQ_600HZ:
182         AD7176_frequency_time = 1666; break;
183
184     case BURST_FREQ_650HZ:
185         AD7176_frequency_time = 1538; break;
186
187     case BURST_FREQ_700HZ:
188         AD7176_frequency_time = 1428; break;
189
190     case BURST_FREQ_750HZ:
191         AD7176_frequency_time = 1333; break;
192
193     case BURST_FREQ_800HZ:
194         AD7176_frequency_time = 1250; break;
195
196     case BURST_FREQ_850HZ:
197         AD7176_frequency_time = 1176; break;
198
199     case BURST_FREQ_900HZ:
200         AD7176_frequency_time = 1111; break;
201
202     case BURST_FREQ_950HZ:
203         AD7176_frequency_time = 1052; break;
204
205     case BURST_FREQ_1000HZ:
206         AD7176_frequency_time = 1000; break;
207
208     case BURST_FREQ_2000HZ:
209         AD7176_frequency_time = 500; break;
210
211     case BURST_FREQ_4000HZ:
212         AD7176_frequency_time = 250; break;
213
214     case BURST_FREQ_6000HZ:
215         AD7176_frequency_time = 167; break;
216
217     case BURST_FREQ_8000HZ:
218         AD7176_frequency_time = 125; break;
219
220     case BURST_FREQ_10000HZ:
221         AD7176_frequency_time = 100; break;
222 }
223
224 AD7176_asynch_counter = 0;
225
226 // Config the timer for the ADC sampling
227 TIMER1config_AD7176(AD7176_frequency_time);
228
229 while(AD7176_asynch_counter != AD7176_values);
230 TIMER1_STOP;
231
232 value_low = AD7176_value_storage[0];
233 value_high = AD7176_value_storage[0];
234
235 for(index = 0 ; index < AD7176_asynch_counter ; index++) {
236
237     if(!matlab_mode) { // If Matlab mode is off
238         UARTprintf("%i\n", AD7176_value_storage[index]);
239     } else { // If Matlab mode is on
240         if(index == AD7176_asynch_counter-1) {
241             UARTprintf("%i", AD7176_value_storage[index]);
242         } else {
243             UARTprintf("%i ", AD7176_value_storage[index]);
244         }
245     }
246
247     if(AD7176_value_storage[index] <= value_low)
248         value_low = AD7176_value_storage[index];
249
250     if(AD7176_value_storage[index] >= value_high)
251         value_high = AD7176_value_storage[index];
252
253 }
254 }
```

```

1  /*****
2  **   File name       : LTC2376.c
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 22/12/2015
5  **   Last Update    : 17/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : LTC2376
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/main.h"
28 #include "header/uart.h"
29 #include "header/spi.h"
30 #include "header/timer.h"
31 #include "header/interrupts.h"
32 #include "header/CC1101.h"
33 #include "header/gpio.h"
34 #include "header/convert.h"
35 #include "header/uart_check.h"
36 #include "header/adc.h"
37 #include "header/LTC2376.h"
38 #include "header/AD7691.h"
39
40 extern uint32_t matlab_mode;
41
42 //*****
43 // AD7691 Test mode
44 // Data declaration for thesting AD7691
45 // This can be deleted after testing the ADC
46 //*****
47 extern volatile uint8_t AD7691_index;
48 extern volatile uint8_t AD7691_count;
49 extern volatile uint32_t AD7691_data[2]; // 24-bit data storage
50 extern volatile uint32_t AD7691_asynch_counter;
51 extern volatile uint32_t AD7691_values;
52 extern volatile uint32_t AD7691_frequency_time;
53 extern volatile uint32_t AD7691_value;
54 extern volatile uint32_t AD7691_value_storage[2000];
55
56 //*****
57 // This function is config the AD7691 ADC
58 //*****
59 void init_ad7691(void) {
60
61     // CNV Output Pin
62     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOM);
63     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_6);
64     AD7691_CNV_SET_LOW;
65
66     // CS LTC2376 Output Pin
67     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);
68     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1);
69     AD7691_CS_DISABLE;
70
71     AD7691_CS_DISABLE;
72 }
73
74 //*****
75 // This function starts the sampling mode
76 //*****
77 void ad7691_start(uint8_t ad7691_frequency, uint8_t burst_values) {
78     uint32_t index = 0;
79
80     uint32_t value_high = 0;
81     uint32_t value_low = 0;
82
83     switch (burst_values) {
84         case BURST_VALUES_50:
85             AD7691_values = 50; break;

```

```
86
87     case BURST_VALUES_100:
88         AD7691_values = 100; break;
89
90     case BURST_VALUES_150:
91         AD7691_values = 150; break;
92
93     case BURST_VALUES_200:
94         AD7691_values = 200; break;
95
96     case BURST_VALUES_250:
97         AD7691_values = 250; break;
98
99     case BURST_VALUES_300:
100        AD7691_values = 300; break;
101
102     case BURST_VALUES_350:
103        AD7691_values = 350; break;
104
105     case BURST_VALUES_400:
106        AD7691_values = 400; break;
107
108     case BURST_VALUES_450:
109        AD7691_values = 450; break;
110
111     case BURST_VALUES_500:
112        AD7691_values = 500; break;
113
114     case BURST_VALUES_550:
115        AD7691_values = 550; break;
116
117     case BURST_VALUES_600:
118        AD7691_values = 600; break;
119
120     case BURST_VALUES_650:
121        AD7691_values = 650; break;
122
123     case BURST_VALUES_700:
124        AD7691_values = 700; break;
125
126     case BURST_VALUES_750:
127        AD7691_values = 750; break;
128
129     case BURST_VALUES_800:
130        AD7691_values = 800; break;
131
132     case BURST_VALUES_850:
133        AD7691_values = 850; break;
134
135     case BURST_VALUES_900:
136        AD7691_values = 900; break;
137
138     case BURST_VALUES_1000:
139        AD7691_values = 1000; break;
140
141     case BURST_VALUES_1500:
142        AD7691_values = 1500; break;
143
144     case BURST_VALUES_1900:
145        AD7691_values = 30000; break;
146 }
147
148 // To calculate the frequency_time
149 // (1/(frequency [Hz]*10^-6))
150 switch(ad7691_frequency) {
151     case BURST_FREQ_50HZ:
152         AD7691_frequency_time = 20000; break;
153
154     case BURST_FREQ_100HZ:
155         AD7691_frequency_time = 10000; break;
156
157     case BURST_FREQ_150HZ:
158         AD7691_frequency_time = 6666; break;
159
160     case BURST_FREQ_200HZ:
161         AD7691_frequency_time = 5000; break;
162
163     case BURST_FREQ_250HZ:
164         AD7691_frequency_time = 4000; break;
165
166     case BURST_FREQ_300HZ:
167         AD7691_frequency_time = 3333; break;
168
169     case BURST_FREQ_350HZ:
170         AD7691_frequency_time = 2857; break;
```

```

171
172     case BURST_FREQ_400HZ:
173         AD7691_frequency_time = 2500; break;
174
175     case BURST_FREQ_450HZ:
176         AD7691_frequency_time = 2222; break;
177
178     case BURST_FREQ_500HZ:
179         AD7691_frequency_time = 2000; break;
180
181     case BURST_FREQ_550HZ:
182         AD7691_frequency_time = 1818; break;
183
184     case BURST_FREQ_600HZ:
185         AD7691_frequency_time = 1666; break;
186
187     case BURST_FREQ_650HZ:
188         AD7691_frequency_time = 1538; break;
189
190     case BURST_FREQ_700HZ:
191         AD7691_frequency_time = 1428; break;
192
193     case BURST_FREQ_750HZ:
194         AD7691_frequency_time = 1333; break;
195
196     case BURST_FREQ_800HZ:
197         AD7691_frequency_time = 1250; break;
198
199     case BURST_FREQ_850HZ:
200         AD7691_frequency_time = 1176; break;
201
202     case BURST_FREQ_900HZ:
203         AD7691_frequency_time = 1111; break;
204
205     case BURST_FREQ_950HZ:
206         AD7691_frequency_time = 1052; break;
207
208     case BURST_FREQ_1000HZ:
209         AD7691_frequency_time = 1000; break;
210
211     case BURST_FREQ_2000HZ:
212         AD7691_frequency_time = 500; break;
213
214     case BURST_FREQ_4000HZ:
215         AD7691_frequency_time = 250; break;
216
217     case BURST_FREQ_6000HZ:
218         AD7691_frequency_time = 167; break;
219
220     case BURST_FREQ_8000HZ:
221         AD7691_frequency_time = 125; break;
222
223     case BURST_FREQ_10000HZ:
224         AD7691_frequency_time = 100; break;
225 }
226
227 AD7691_asynch_counter = 0;
228 TIMER1config_AD7691 (AD7691_frequency_time);
229
230 while (AD7691_asynch_counter != AD7691_values);
231 TIMER1_STOP;
232
233 value_low = AD7691_value_storage [0];
234 value_high = AD7691_value_storage [0];
235
236 for (index = 0 ; index < AD7691_asynch_counter ; index++) {
237
238     if (!matlab_mode) { // If Matlab mode is off
239         UARTprintf ("%i\n", AD7691_value_storage [index]);
240     } else { // If Matlab mode is on
241         if (index == AD7691_asynch_counter - 1) {
242             UARTprintf ("%i", AD7691_value_storage [index]);
243         } else {
244             UARTprintf ("%i ", AD7691_value_storage [index]);
245         }
246     }
247
248     if (AD7691_value_storage [index] <= value_low)
249         value_low = AD7691_value_storage [index];
250
251     if (AD7691_value_storage [index] >= value_high)
252         value_high = AD7691_value_storage [index];
253 }
254 }

```

```

1  /*****
2  **   File name       : adc.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 17/09/2014
5  **   Last Update     : 17/07/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : ADC
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include <stdbool.h>
11 #include <stdint.h>
12 #include "inc/hw_memmap.h"
13 #include "driverlib/adc.h"
14 #include "driverlib/gpio.h"
15 #include "driverlib/pin_map.h"
16 #include "driverlib/sysctl.h"
17 #include "driverlib/uart.h"
18 #include "utils/uartstdio.h"
19
20 void init_adc() {
21     // The ADC0 peripheral must be enabled for use.
22     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
23
24     // Using PE3 -> This pin is AIN0
25     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
26     GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_3);
27
28     // Enable sample sequence 3 with a processor signal trigger. Sequence 3
29     // will do a single sample when the processor sends a signal to start the
30     // conversion. Each ADC module has 4 programmable sequences, sequence 0
31     // to sequence 3. This example is arbitrarily using sequence 3.
32     ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
33
34     // Configure step 0 on sequence 3. Sample channel 0 (ADC_CTL_CH0) in
35     // single-ended mode (default) and configure the interrupt flag
36     // (ADC_CTL_IE) to be set when the sample is done. Tell the ADC logic
37     // that this is the last conversion on sequence 3 (ADC_CTL_END). Sequence
38     // 3 has only one programmable step. Sequence 1 and 2 have 4 steps, and
39     // sequence 0 has 8 programmable steps. Since we are only doing a single
40     // conversion using sequence 3 we will only configure step 0. For more
41     // information on the ADC sequences and steps, reference the datasheet.
42     ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH0 | ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END);
43
44     // Since sample sequence 3 is now configured, it must be enabled.
45     ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 3);
46
47     // Clear the interrupt status flag. This is done to make sure the
48     // interrupt flag is cleared before we sample.
49     ADCIntClear(ADC0_BASE, 3);
50
51 }
52
53 uint32_t read_adc() {
54     uint32_t pui32ADC0Value[1];
55
56     // Trigger the ADC conversion.
57     ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3);
58
59     // Wait for conversion to be completed.
60     while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false))
61
62     // Clear the ADC interrupt flag.
63     ADCIntClear(ADC0_BASE, 3);
64
65     // Read ADC Value.
66     ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 3, pui32ADC0Value);
67
68     return pui32ADC0Value[0];
69 }

```

```

1  /*****
2  **   File name       : CC1101.c
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 20/08/2014
5  **   Last Update    : 17/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : CC1101
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/uart.h"
28 #include "header/interrupts.h"
29 #include "header/cc1101.h"
30 #include "header/spi.h"
31 #include "header/timer.h"
32
33 // Private function declaration
34 void cc1101_config_tx(uint8_t brate);
35 void cc1101_config_rx(uint8_t brate);
36 void cc1101_tx(unsigned long packetes_to_tx);
37 void cc1101_rx(uint8_t);
38
39 void cc1101_set_rx(unsigned long brate);
40
41 void cc1101_fill_tx_fifo(uint8_t *, uint8_t );
42
43 void wakeup(void);
44
45 void cc1101_enable_crc(void);
46
47 uint8_t cc1101_spi_read_register(uint8_t address);
48 void cc1101_spi_read_register_burst(uint8_t , uint8_t *, uint8_t );
49
50 extern volatile uint8_t tx_data_length;
51
52 /*****
53 ** Communication states
54 *****/
55 extern volatile uint8_t command_recived_flag;
56
57 extern volatile uint8_t brate_start;
58 extern volatile uint8_t brate;
59 extern volatile uint16_t asynch_counter;
60 extern uint32_t rx_timeout;
61 extern uint32_t tx_timeout;
62
63 /*****
64 ** Interruptflags
65 *****/
66 extern volatile uint8_t irq_mode; // PORT1 IRQ Status
67 extern volatile uint8_t irq_send_done_flag; // CC1101 senden
68 extern volatile uint8_t irq_cali_flag; // Flag for burat calibration
69
70
71 //*****
72 //*** public functions *****/
73 //*****
74
75 //*****
76 // This function is nessesary to start up the CC1101
77 //*****
78 void cc1101_power_up_reset(void) {
79
80     // Enable the TX LED on the Tranceiver Board V0.4
81     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
82     GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_1);
83
84     // Enable the RX LED on the Tranceiver Board V0.4
85     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);

```

```

86     GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_4);
87
88     // Enable the Chip select Port: Pin Q1
89     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ);
90     GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1);
91
92     // Set GDO0
93     CC1101_GDO0_SET_INPUT;
94
95     // Set GDO2 and the interrupt
96     CC1101_GDO2_SET_INPUT;
97     GPIOPinTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_6, GPIO_RISING_EDGE);
98     GPIOIntDisable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_INT_PIN_6);
99     IntDisable(INT_GPIOK);
100
101     // Manual power-on reset
102     CS_ENABLE;
103     delay_ms(3);
104
105     CS_DISABLE;
106     delay_ms(3);
107
108     CS_ENABLE;
109     delay_ms(3);
110
111     CS_DISABLE;
112     delay_ms(3);
113
114     cc1101_reset();
115 }
116
117 //*****
118 // Function to configure the CC1101 for TX packages
119 //*****
120 void tx_packet(uint8_t packetes, uint8_t *txbuf) {
121
122     CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ; // Clear the sync word detected interrupt
123     CC1101_GDO2_IRQ_ENABLE; // Enable the sync word detected interrupt
124
125     TX_DONE_UNSET; // Unset the IRQ flags
126     IRQ_SET_TX;
127
128     cc1101_set_tx(brate);
129     cc1101_fill_tx_fifo(txbuf, packetes);
130     cc1101_tx(packetes);
131
132     TX_LED_ON; // Turn the TX LED on
133     timeout_start(tx_timeout); // Start the timeout timer
134
135     while ((!TX_DONE_IS_SET)&&(!TIMEOUT_IS_SET)); // Wait until data was send
136     //delay_ms(1);
137
138     TX_LED_OFF; // Turn the TX LED off
139
140     tx_data_length = 0; // Reset the data length
141
142     cc1101_idle(); // Go to the idle mode
143 }
144
145 //*****
146 // This function configure the CC1101 for the RX mode
147 //*****
148 void rx_packet(uint8_t packages) {
149     CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ; // Clear the sync word detected interrupt
150     CC1101_GDO2_IRQ_DISABLE; // Enable the sync word detected interrupt
151
152     cc1101_set_rx(brate); // Set the CC1101 for the RX mode
153     cc1101_rx(packages); // Transceiver in RX state
154
155     COMMAND_REVIVED_UNSET; // Unset the IRQ flags
156     IRQ_SET_RX;
157
158     CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ; // Clear the sync word detected interrupt
159     CC1101_GDO2_IRQ_ENABLE; // Enable the sync word detected interrupt
160
161     timeout_start(rx_timeout); // Start the timeout timer
162     while ((!COMMAND_REVIVED_IS_SET)&&(!TIMEOUT_IS_SET)); // Wait until data packages are received or timeout is
163     arrived
164
165     if (COMMAND_REVIVED_IS_SET)
166         timeout_stop();
167 }
168 //*****
169 // This function starts the asynchronous mode

```



```

170 //*****
171 void cc1101_tx_asynchronous_mode(void) {
172     uint32_t spiSendData[1];
173
174     spiSendData[0] = CC1101_CS_STX;
175     SPI_send_data(1, spiSendData);
176 }
177
178 //*****
179 // This function starts the asynchronous mode
180 //*****
181 void cc1101_rx_asynchronous_mode(void) {
182     uint32_t spiSendData[1];
183
184     spiSendData[0] = CC1101_CS_SRX;
185     SPI_send_data(1, spiSendData);
186 }
187
188 //*****
189 // This function read out the RX FIFO
190 //*****
191 void cc1101_read_rx_fifo(uint8_t *buffer, uint8_t length) {
192     // Disable the receiver
193     cc1101_idle();
194
195     // Transfer the bytes via SPI from the RX fifo
196     cc1101_spi_read_register_burst(CC1101_ML_RXFIFO, buffer, length);
197 }
198
199 //*****
200 // This function returns the number of the received bytes
201 //*****
202 uint8_t cc1101_get_rxbytes(void) {
203     return (cc1101_spi_read_register(CC1101_SR_RXBYTES) & 0x7F);
204 }
205
206 //*****
207 // This function starts the burst measurement mode
208 //*****
209 void burst_start(uint8_t burst_frequency, uint8_t burst_values) {
210
211     uint8_t packet[4];
212     uint32_t values = 0;
213     uint32_t frequency_time = 0;
214
215     switch (burst_values) {
216     case BURST_VALUES_50:
217         values = 50;
218         break;
219
220     case BURST_VALUES_100:
221         values = 100;
222         break;
223
224     case BURST_VALUES_150:
225         values = 150;
226         break;
227
228     case BURST_VALUES_200:
229         values = 200;
230         break;
231
232     case BURST_VALUES_250:
233         values = 250;
234         break;
235
236     case BURST_VALUES_300:
237         values = 300;
238         break;
239
240     case BURST_VALUES_350:
241         values = 350;
242         break;
243
244     case BURST_VALUES_400:
245         values = 400;
246         break;
247
248     case BURST_VALUES_450:
249         values = 450;
250         break;
251
252     case BURST_VALUES_500:
253         values = 500;
254         break;

```

```
255
256     case BURST_VALUES_550:
257         values = 550;
258     break;
259
260     case BURST_VALUES_600:
261         values = 600;
262     break;
263
264     case BURST_VALUES_650:
265         values = 650;
266     break;
267
268     case BURST_VALUES_700:
269         values = 700;
270     break;
271
272     case BURST_VALUES_750:
273         values = 750;
274     break;
275
276     case BURST_VALUES_800:
277         values = 800;
278     break;
279
280     case BURST_VALUES_850:
281         values = 850;
282     break;
283
284     case BURST_VALUES_900:
285         values = 900;
286     break;
287
288     case BURST_VALUES_1000:
289         values = 1000;
290     break;
291
292     case BURST_VALUES_1500:
293         values = 1500;
294     break;
295
296     case BURST_VALUES_1900:
297         values = 1900;
298     break;
299
300     case BURST_VALUES_2000:
301         values = 2000;
302     break;
303
304     case BURST_VALUES_2500:
305         values = 2500;
306     break;
307
308 }
309
310 // To calculate the frequency_time
311 // (1/(frequency [Hz]*10-6))
312 switch (burst_frequency) {
313     case BURST_FREQ_50HZ: // 50.00Hz
314         frequency_time = 2400000; break;
315
316     case BURST_FREQ_100HZ: // 100Hz
317         frequency_time = 1199100; break;
318
319     case BURST_FREQ_150HZ: // 150Hz
320         frequency_time = 799800; break;
321
322     case BURST_FREQ_200HZ:
323         frequency_time = 599900; break;
324
325     case BURST_FREQ_250HZ:
326         frequency_time = 480000; break;
327
328     case BURST_FREQ_300HZ:
329         frequency_time = 400000; break;
330
331     case BURST_FREQ_350HZ:
332         frequency_time = 342857; break;
333
334     case BURST_FREQ_400HZ:
335         frequency_time = 300000; break;
336
337     case BURST_FREQ_450HZ:
338         frequency_time = 266667; break;
339
```

```
340     case BURST_FREQ_500HZ: // 500Hz
341         frequency_time = 239648; break;
342
343     case BURST_FREQ_550HZ:
344         frequency_time = 218182; break;
345
346     case BURST_FREQ_600HZ: // 600Hz
347         frequency_time = 199648; break;
348
349     case BURST_FREQ_650HZ:
350         frequency_time = 184615; break;
351
352     case BURST_FREQ_700HZ:
353         frequency_time = 171429; break;
354
355     case BURST_FREQ_750HZ:
356         frequency_time = 160000; break;
357
358     case BURST_FREQ_800HZ:
359         frequency_time = 150000; break;
360
361     case BURST_FREQ_850HZ:
362         frequency_time = 141176; break;
363
364     case BURST_FREQ_900HZ:
365         frequency_time = 133333; break;
366
367     case BURST_FREQ_950HZ:
368         frequency_time = 126316; break;
369
370     case BURST_FREQ_1000HZ: // 1.000Hz
371         frequency_time = 119610; break;
372
373     case BURST_FREQ_2000HZ: // 2.000Hz
374         frequency_time = 59648; break;
375
376     case BURST_FREQ_4000HZ: // 4.000Hz
377         frequency_time = 29648; break;
378
379     case BURST_FREQ_6000HZ: // 5.999Hz
380         frequency_time = 19648; break;
381
382     case BURST_FREQ_8000HZ: // 8.000Hz
383         frequency_time = 14648; break;
384
385     case BURST_FREQ_10000HZ: // 10kHz
386         frequency_time = 11624; break;
387
388     case BURST_FREQ_12000HZ:
389         frequency_time = 10000; break;
390
391     case BURST_FREQ_14000HZ:
392         frequency_time = 8571; break;
393
394     case BURST_FREQ_16000HZ:
395         frequency_time = 7500; break;
396
397     case BURST_FREQ_18000HZ:
398         frequency_time = 6667; break;
399
400     case BURST_FREQ_20000HZ: // 20kHz
401         frequency_time = 5628; break;
402
403     case BURST_FREQ_22000HZ:
404         frequency_time = 5455; break;
405
406     case BURST_FREQ_24000HZ:
407         frequency_time = 5000; break;
408
409     case BURST_FREQ_26000HZ:
410         frequency_time = 4615; break;
411
412     case BURST_FREQ_28000HZ:
413         frequency_time = 4286; break;
414
415     case BURST_FREQ_30000HZ: // 30.01kHz
416         frequency_time = 3627; break;
417
418     case BURST_FREQ_32000HZ:
419         frequency_time = 3750; break;
420
421     case BURST_FREQ_34000HZ:
422         frequency_time = 3529; break;
423
424     case BURST_FREQ_36000HZ:
```

```

425         frequency_time = 3333; break;
426
427     case BURST_FREQ_38000HZ:
428         frequency_time = 3158; break;
429
430     case BURST_FREQ_40000HZ: // 40.01kHz
431         frequency_time = 2627; break;
432
433     case BURST_FREQ_45000HZ:
434         frequency_time = 2667; break;
435
436     case BURST_FREQ_50000HZ: // 50.02kHz
437         frequency_time = 2027; break;
438
439     case BURST_FREQ_55000HZ:
440         frequency_time = 2182; break;
441
442     case BURST_FREQ_60000HZ: // 60.03kHz
443         frequency_time = 1627; break;
444
445     case BURST_FREQ_65000HZ:
446         frequency_time = 1846; break;
447
448     case BURST_FREQ_70000HZ: // 69.93kHz
449         frequency_time = 1339; break;
450
451     case BURST_FREQ_75000HZ:
452         frequency_time = 1600; break;
453
454     case BURST_FREQ_80000HZ: // 80.0kHz
455         frequency_time = 1128; break;
456
457     case BURST_FREQ_85000HZ:
458         frequency_time = 1412 - 354; break;
459
460     case BURST_FREQ_90000HZ: // 90.09kHz
461         frequency_time = 960; break;
462
463     case BURST_FREQ_95000HZ:
464         frequency_time = 1263; break;
465
466     case BURST_FREQ_100000HZ:
467         frequency_time = 1200; break;
468
469 }
470
471 packet[0] = BROADCAST;
472 packet[1] = COMMAND_DOWNLINK_BURST_MODE;
473 packet[2] = burst_frequency;
474 packet[3] = burst_values;
475
476 tx_data_length = 0; // Normal Data length
477 tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
478
479 // Start the burts messurment
480 CC1101_GDO2_IRQ_DISABLE;
481 CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ;
482
483 CC1101_GDO0_SET_INPUT;
484 cc1101_reset(); // Reset all registers to their default values and go to idle state
485 cc1101_config_burst_tx(); // Configure the transceiver for sending the wakeup signal
486 cc1101_tx_asynchronous_mode(); // Change to TX state
487
488 CC1101_GDO0_SET_OUTPUT;
489 CC1101_GDO0_SET_HIGH;
490
491 asynch_counter = 0;
492 delay_ms(100);
493 TIMER1config(frequency_time);
494
495 while(asynch_counter != values);
496 ROM_TimerDisable(TIMER1_BASE, TIMER_A);
497 CC1101_GDO0_SET_INPUT;
498
499 packet[0] = BROADCAST;
500 packet[1] = COMMAND_DOWNLINK_BURST_CHECK;
501 packet[2] = 0x00;
502 packet[3] = 0x00;
503
504 tx_data_length = 0; // Normal Data length
505 tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
506 }
507
508 //*****
509 //*** private functions *****/

```

```

510 //*****
511
512 //*****
513 // This function sets the CC1101 in the TX mode
514 //*****
515 void cc1101_set_tx(unsigned long brate) {
516
517     cc1101_reset(); // Reset chip and go to idle state
518     cc1101_config_tx(brate); // Configure the CC1101 for sending packets
519 }
520
521 //*****
522 // This function sets the CC1101 in the RX mode
523 //*****
524 void cc1101_set_rx(unsigned long brate) {
525
526     cc1101_reset(); // Reset chip and go to idle state
527     cc1101_config_rx(brate); // Configure the CC1101 for receiving packets
528 }
529
530 //*****
531 // This function resets the CC1101
532 //*****
533 void cc1101_reset(void) {
534     uint32_t spiSendData[0];
535     uint32_t index = 0;
536
537     spiSendData[0] = 0x30;
538     SPI_send_data(1, spiSendData);
539
540     // // TODO: Ändern in 5ms
541     // delay_ms(1); // Time to reset
542
543     for(index=0;index <=1200;index++)
544         asm("NOP");
545 }
546
547 //*****
548 // This starts the TX Mode and TX the data
549 //*****
550 void cc1101_tx(unsigned long packetes_to_tx) {
551     uint32_t spiSendData[2];
552
553     // DATA packet length
554     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTLEN;
555     spiSendData[1] = packetes_to_tx;
556     SPI_send_data(2, spiSendData);
557
558     // TX state
559     spiSendData[0] = CC1101_CS_STX;
560     SPI_send_data(1, spiSendData);
561
562     // Wait 5 ms for TX finished
563     delay_ms(5);
564 }
565
566 //*****
567 // This function strobes the command to clear the TX FIFO
568 //*****
569 void cc1101_clear_tx_fifo(void) {
570     uint32_t spiSendData[1];
571
572     spiSendData[0] = CC1101_CS_SFTX;
573     SPI_send_data(1, spiSendData);
574 }
575
576 //*****
577 // This function strobes the command to fill the TX FIFO
578 //*****
579 void cc1101_fill_tx_fifo(uint8_t * buffer, uint8_t length) {
580     uint32_t i;
581
582     uint32_t spiSendData[5];
583
584     // Clear TX FIFO
585     cc1101_clear_tx_fifo();
586
587     // Transfer the bytes via SPI to the TX fifo of the transceiver
588     spiSendData[0] = CC1101_ML_TXFIFO_BURST | CC1101_WRITE_BURST;
589     for (i = 1; i < length+1; i++) {
590         spiSendData[i] = buffer[i-1];
591     }
592     SPI_send_data(5, spiSendData);
593 }
594 }

```

```

595
596 //*****
597 // This function strobes the command to go in the idle mode
598 //*****
599 void cc1101_idle(void) {
600     uint32_t spiSendData[1];
601
602     spiSendData[0] = CC1101_CS_SIDLE;
603     SPI_send_data(1, spiSendData);
604 }
605
606 //*****
607 // This function sets the CRC Mode in the CC1101
608 //*****
609 void cc1101_enable_crc(void) {
610     // Read the current state of the Register, that includes the CRC Bit
611     uint8_t current = cc1101_spi_read_register(CC1101_CR_PKTCTRL0);
612
613     uint32_t spiSendData[3];
614
615     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;
616     spiSendData[1] = current | 0x04;
617     SPI_send_data(2, spiSendData);
618 }
619
620 //*****
621 // This function readout a register in the CC1101 and
622 // return this
623 //*****
624 uint8_t cc1101_spi_read_register(uint8_t address) {
625     uint32_t x[7]={0};
626
627     CS_ENABLE;
628     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, (address | CC1101_READ_SINGLE));
629
630     // Clear the RX FIFO
631     while(SSIDataGetNonBlocking(SSI3_BASE, &x[0]));
632
633     // Wait untill SSI3 is ready
634     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
635
636     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, 0x00);
637     SSIDataGetNonBlocking(SSI3_BASE,&x[0]);
638
639     x[0] &= 0x00FF;
640
641     // Wait untill SSI3 is ready
642     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
643
644     CS_DISABLE;
645
646     return x[0];
647 }
648
649 //*****
650 // This function readout a burst register in the CC1101 and
651 // return this
652 //*****
653 void cc1101_spi_read_register_burst(uint8_t address, uint8_t *buffer, uint8_t count) {
654     uint8_t i = 0;
655     uint32_t x;
656
657     CS_ENABLE;
658     GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 1);
659
660     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, (address | CC1101_READ_BURST));
661
662     // Clear the RX FIFO
663     while(SSIDataGetNonBlocking(SSI3_BASE, &x));
664
665     // Wait untill SSI3 is ready
666     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
667
668     // Dummy read
669     SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, 0x00);
670     SSIDataGetNonBlocking(SSI3_BASE,&x);
671
672     // Wait untill SSI3 is ready
673     while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
674
675     for (i = 0; i < count; i++) {
676
677         SSIDataPutNonBlocking(SSI3_BASE, 0x00);
678         SSIDataGetNonBlocking(SSI3_BASE,&x);
679

```

```

680     buffer[i] = x & 0x00FF;
681
682     // Wait untill SSI3 is ready
683     while (SSI3Busy (SSI3_BASE));
684 }
685 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
686
687 CS_DISABLE;
688
689 }
690
691 void cc1101_config_tx(uint8_t brate) {
692     uint32_t spiSendData[4];
693
694     // Rising edge on GDO0 when packet received and CRC check OK
695     // (Deasserted when first byte is read from RX FIFO)
696     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG0;
697     spiSendData[1] = 0x07;
698     SPI_send_data(2, spiSendData);
699
700     // Rising edge on GDO2 when sync word has been received
701     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG2;
702     spiSendData[1] = 0x06;
703     SPI_send_data(2, spiSendData);
704
705     // The 4 SYNC bytes: 0x12 0x09 (repeated once)
706     spiSendData[0] = CC1101_CR_SYNC1;
707     spiSendData[1] = 0x81;
708     SPI_send_data(2, spiSendData);
709
710     spiSendData[0] = CC1101_CR_SYNC0;
711     spiSendData[1] = 0x81;
712     SPI_send_data(2, spiSendData);
713
714     // Flush RX packets when CRC is not OK, Address check and 0x00 broadcast
715     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL1;
716     spiSendData[1] = 0x0A;
717     SPI_send_data(2, spiSendData);
718
719     // No whitening, FIFO mode, CRC disable, Fixed packet length
720     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;
721     spiSendData[1] = 0x04;
722     SPI_send_data(2, spiSendData); //0x04 für CRC!
723
724     // Device Address
725     spiSendData[0] = CC1101_CR_ADDR;
726     spiSendData[1] = 0x00;
727     SPI_send_data(2, spiSendData);
728
729     // Channel 0
730     spiSendData[0] = CC1101_CR_CHANNR;
731     spiSendData[1] = 0x00;
732     SPI_send_data(2, spiSendData);
733
734     // IF frequency: 152.34375 kHz
735     spiSendData[0] = CC1101_CR_FSCTRL1;
736     spiSendData[1] = 0x06;
737     SPI_send_data(2, spiSendData);
738
739     // Carrier frequency: 433.999969 MHz
740     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ2;
741     spiSendData[1] = 0x10;
742     SPI_send_data(2, spiSendData);
743
744     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ1;
745     spiSendData[1] = 0xB1;
746     SPI_send_data(2, spiSendData);
747
748     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ0;
749     spiSendData[1] = 0x3B;
750     SPI_send_data(2, spiSendData);
751
752     switch (brate) {
753         /*****
754         ** 40 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
755         ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
756         *****/
757         case 40: {
758             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
759             spiSendData[1] = 0x8A;
760             SPI_send_data(2, spiSendData);
761
762             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
763             spiSendData[1] = 0x93;
764             SPI_send_data(2, spiSendData);

```

```
765
766     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
767     spiSendData[1] = 0x33;
768     SPI_send_data(2, spiSendData);
769
770     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
771     spiSendData[1] = 0x22;
772     SPI_send_data(2, spiSendData);
773
774     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
775     spiSendData[1] = 0x7A;
776     SPI_send_data(2, spiSendData);
777 } break;
778
779 /*****
780 ** 59.906 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
781 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
782 *****/
783 case 60: {
784     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
785     spiSendData[1] = 0x8B;
786     SPI_send_data(2, spiSendData);
787
788     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
789     spiSendData[1] = 0x2E;
790     SPI_send_data(2, spiSendData);
791
792     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
793     spiSendData[1] = 0x33;
794     SPI_send_data(2, spiSendData);
795
796     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
797     spiSendData[1] = 0x22;
798     SPI_send_data(2, spiSendData);
799
800     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
801     spiSendData[1] = 0x7A;
802     SPI_send_data(2, spiSendData);
803 } break;
804
805 /*****
806 ** 79.9408 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
807 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
808 *****/
809 case 80: {
810     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
811     spiSendData[1] = 0x8B;
812     SPI_send_data(2, spiSendData);
813
814     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
815     spiSendData[1] = 0x93;
816     SPI_send_data(2, spiSendData);
817
818     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
819     spiSendData[1] = 0x33;
820     SPI_send_data(2, spiSendData);
821
822     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
823     spiSendData[1] = 0x22;
824     SPI_send_data(2, spiSendData);
825
826     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
827     spiSendData[1] = 0x7A;
828     SPI_send_data(2, spiSendData);
829 } break;
830
831 /*****
832 ** 99.9756 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
833 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
834 *****/
835 case 100: {
836     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
837     spiSendData[1] = 0x8B;
838     SPI_send_data(2, spiSendData);
839
840     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
841     spiSendData[1] = 0xF8;
842     SPI_send_data(2, spiSendData);
843
844     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
845     spiSendData[1] = 0x33;
846     SPI_send_data(2, spiSendData);
847
848     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
849     spiSendData[1] = 0x22;
```



```
850     SPI_send_data(2, spiSendData);
851
852     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
853     spiSendData[1] = 0x7A;
854     SPI_send_data(2, spiSendData);
855 } break;
856
857 /******
858 ** 119.812 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
859 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
860 *****/
861 case 120: {
862     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
863     spiSendData[1] = 0x8C;
864     SPI_send_data(2, spiSendData);
865
866     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
867     spiSendData[1] = 0x2E;
868     SPI_send_data(2, spiSendData);
869
870     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
871     spiSendData[1] = 0x33;
872     SPI_send_data(2, spiSendData);
873
874     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
875     spiSendData[1] = 0x22;
876     SPI_send_data(2, spiSendData);
877
878     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
879     spiSendData[1] = 0x7A;
880     SPI_send_data(2, spiSendData);
881 } break;
882
883 /******
884 ** 140.045 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
885 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
886 *****/
887 case 140: {
888     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
889     spiSendData[1] = 0x8C;
890     SPI_send_data(2, spiSendData);
891
892     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
893     spiSendData[1] = 0x61;
894     SPI_send_data(2, spiSendData);
895
896     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
897     spiSendData[1] = 0x33;
898     SPI_send_data(2, spiSendData);
899
900     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
901     spiSendData[1] = 0x22;
902     SPI_send_data(2, spiSendData);
903
904     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
905     spiSendData[1] = 0x7A;
906     SPI_send_data(2, spiSendData);
907 } break;
908
909 /******
910 ** 159.882 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
911 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
912 *****/
913 case 160: {
914     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
915     spiSendData[1] = 0x8C;
916     SPI_send_data(2, spiSendData);
917
918     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
919     spiSendData[1] = 0x93;
920     SPI_send_data(2, spiSendData);
921
922     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
923     spiSendData[1] = 0x33;
924     SPI_send_data(2, spiSendData);
925
926     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
927     spiSendData[1] = 0x22;
928     SPI_send_data(2, spiSendData);
929
930     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
931     spiSendData[1] = 0x7A;
932     SPI_send_data(2, spiSendData);
933 } break;
934
```

```

935      /*****
936      ** 180.115 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
937      ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
938      *****/
939      case 180: {
940          spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
941          spiSendData[1] = 0x8C;
942          SPI_send_data(2, spiSendData);
943
944          spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
945          spiSendData[1] = 0xC6;
946          SPI_send_data(2, spiSendData);
947
948          spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
949          spiSendData[1] = 0x33;
950          SPI_send_data(2, spiSendData);
951
952          spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
953          spiSendData[1] = 0x22;
954          SPI_send_data(2, spiSendData);
955
956          spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
957          spiSendData[1] = 0x7A;
958          SPI_send_data(2, spiSendData);
959      } break;
960
961  }
962
963  // Calibrate when going from IDLE to RX or TX, Crystal off when in SLEEP state
964  spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM0;
965  spiSendData[1] = 0x10;
966  SPI_send_data(2, spiSendData);
967
968  // FCL gain: 3000, Saturation point for the frequency offset compensation algorithm -> SmartRF Studio
969  spiSendData[0] = CC1101_CR_FOCCFG;
970  spiSendData[1] = 0x16;
971  SPI_send_data(2, spiSendData);
972
973  spiSendData[0] = 0x7E;
974  spiSendData[1] = 0x12;
975  spiSendData[2] = 0xc0;
976  spiSendData[3] = 0x02;
977  SPI_send_data(4, spiSendData);
978
979  // 10 dBm output power
980  spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND0;
981  spiSendData[1] = 0x11;
982  SPI_send_data(2, spiSendData);
983  }
984
985  void cc1101_config_rx(uint8_t brate) {
986      uint32_t spiSendData[3];
987
988      // Rising edge on GDO0 when packet received and CRC check OK
989      // (Deasserted when first byte is read from RX FIFO)
990      spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG0;
991      spiSendData[1] = 0x07;
992      SPI_send_data(2, spiSendData);
993
994      // Rising edge on GDO2 when sync word has been received
995      spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG2;
996      spiSendData[1] = 0x06;
997      SPI_send_data(2, spiSendData);
998
999      // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
1000     spiSendData[0] = CC1101_CR_FIFOTHR;
1001     spiSendData[1] = 0x47;
1002     SPI_send_data(2, spiSendData);
1003
1004     // The 4 SYNC bytes: 0x12 0x09 (repeated once)
1005     spiSendData[0] = CC1101_CR_SYNC1;
1006     spiSendData[1] = 0x81;
1007     SPI_send_data(2, spiSendData);
1008
1009     spiSendData[0] = CC1101_CR_SYNC0;
1010     spiSendData[1] = 0x81;
1011     SPI_send_data(2, spiSendData);
1012
1013     // Flush RX packets when CRC is not OK, Address check and 0x00 broadcast
1014     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL1;
1015     spiSendData[1] = 0x04;
1016     SPI_send_data(2, spiSendData);
1017
1018     // No whitening, FIFO mode, CRC disable, Fixed packet length
1019     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;

```

```

1020     spiSendData[1] = 0x00;
1021     SPI_send_data(2, spiSendData);
1022
1023     // Device Address
1024     spiSendData[0] = CC1101_CR_ADDR;
1025     spiSendData[1] = 0x00;
1026     SPI_send_data(2, spiSendData);
1027
1028     // Channel 0
1029     spiSendData[0] = CC1101_CR_CHANNR;
1030     spiSendData[1] = 0x00;
1031     SPI_send_data(2, spiSendData);
1032
1033     // IF frequency: 152.34375 kHz
1034     spiSendData[0] = CC1101_CR_FSCTRL1;
1035     spiSendData[1] = 0x06;
1036     SPI_send_data(2, spiSendData);
1037
1038     // Carrier frequency: 433.999969 MHz
1039     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ2;
1040     spiSendData[1] = 0x10;
1041     SPI_send_data(2, spiSendData);
1042
1043     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ1;
1044     spiSendData[1] = 0xB1;
1045     SPI_send_data(2, spiSendData);
1046
1047     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ0;
1048     spiSendData[1] = 0x3B;
1049     SPI_send_data(2, spiSendData);
1050
1051     switch(brate) {
1052         /*****
1053         ** 40 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
1054         ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1055         *****/
1056         case 40: {
1057             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1058             spiSendData[1] = 0x8A;
1059             SPI_send_data(2, spiSendData);
1060
1061             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1062             spiSendData[1] = 0x93;
1063             SPI_send_data(2, spiSendData);
1064
1065             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1066             spiSendData[1] = 0x33;
1067             SPI_send_data(2, spiSendData);
1068
1069             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1070             spiSendData[1] = 0x22;
1071             SPI_send_data(2, spiSendData);
1072
1073             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1074             spiSendData[1] = 0x7A;
1075             SPI_send_data(2, spiSendData);
1076         } break;
1077
1078         /*****
1079         ** 59.906 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
1080         ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1081         *****/
1082         case 60: {
1083             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1084             spiSendData[1] = 0x8B;
1085             SPI_send_data(2, spiSendData);
1086
1087             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1088             spiSendData[1] = 0x2E;
1089             SPI_send_data(2, spiSendData);
1090
1091             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1092             spiSendData[1] = 0x33;
1093             SPI_send_data(2, spiSendData);
1094
1095             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1096             spiSendData[1] = 0x22;
1097             SPI_send_data(2, spiSendData);
1098
1099             spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1100             spiSendData[1] = 0x7A;
1101             SPI_send_data(2, spiSendData);
1102         } break;
1103
1104         /*****

```

```
1105     ** 79.9408 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
1106     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1107     *****/
1108     case 80: {
1109         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1110         spiSendData[1] = 0x8B;
1111         SPI_send_data(2, spiSendData);
1112
1113         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1114         spiSendData[1] = 0x93;
1115         SPI_send_data(2, spiSendData);
1116
1117         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1118         spiSendData[1] = 0x33;
1119         SPI_send_data(2, spiSendData);
1120
1121         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1122         spiSendData[1] = 0x22;
1123         SPI_send_data(2, spiSendData);
1124
1125         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1126         spiSendData[1] = 0x7A;
1127         SPI_send_data(2, spiSendData);
1128     } break;
1129
1130     /******
1131     ** 99.9756 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
1132     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1133     *****/
1134     case 100: {
1135         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1136         spiSendData[1] = 0x8B;
1137         SPI_send_data(2, spiSendData);
1138
1139         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1140         spiSendData[1] = 0xF8;
1141         SPI_send_data(2, spiSendData);
1142
1143         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1144         spiSendData[1] = 0x33;
1145         SPI_send_data(2, spiSendData);
1146
1147         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1148         spiSendData[1] = 0x22;
1149         SPI_send_data(2, spiSendData);
1150
1151         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1152         spiSendData[1] = 0x7A;
1153         SPI_send_data(2, spiSendData);
1154     } break;
1155
1156     /******
1157     ** 119.812 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
1158     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1159     *****/
1160     case 120: {
1161         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1162         spiSendData[1] = 0x8C;
1163         SPI_send_data(2, spiSendData);
1164
1165         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1166         spiSendData[1] = 0x2E;
1167         SPI_send_data(2, spiSendData);
1168
1169         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1170         spiSendData[1] = 0x33;
1171         SPI_send_data(2, spiSendData);
1172
1173         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1174         spiSendData[1] = 0x22;
1175         SPI_send_data(2, spiSendData);
1176
1177         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1178         spiSendData[1] = 0x7A;
1179         SPI_send_data(2, spiSendData);
1180     } break;
1181
1182     /******
1183     ** 140.045 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
1184     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1185     *****/
1186     case 140: {
1187         spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1188         spiSendData[1] = 0x8C;
1189         SPI_send_data(2, spiSendData);
```

```

1190
1191     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1192     spiSendData[1] = 0x61;
1193     SPI_send_data(2, spiSendData);
1194
1195     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1196     spiSendData[1] = 0x33;
1197     SPI_send_data(2, spiSendData);
1198
1199     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1200     spiSendData[1] = 0x22;
1201     SPI_send_data(2, spiSendData);
1202
1203     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1204     spiSendData[1] = 0x7A;
1205     SPI_send_data(2, spiSendData);
1206 }break;
1207
1208 /******
1209 ** 159.882 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
1210 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1211 *****/
1212 case 160: {
1213     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1214     spiSendData[1] = 0x8C;
1215     SPI_send_data(2, spiSendData);
1216
1217     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1218     spiSendData[1] = 0x93;
1219     SPI_send_data(2, spiSendData);
1220
1221     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1222     spiSendData[1] = 0x33;
1223     SPI_send_data(2, spiSendData);
1224
1225     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1226     spiSendData[1] = 0x22;
1227     SPI_send_data(2, spiSendData);
1228
1229     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1230     spiSendData[1] = 0x7A;
1231     SPI_send_data(2, spiSendData);
1232 }break;
1233
1234 /******
1235 ** 180.115 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
1236 ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
1237 *****/
1238 case 180: {
1239     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1240     spiSendData[1] = 0x8C;
1241     SPI_send_data(2, spiSendData);
1242
1243     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1244     spiSendData[1] = 0xC6;
1245     SPI_send_data(2, spiSendData);
1246
1247     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1248     spiSendData[1] = 0x33;
1249     SPI_send_data(2, spiSendData);
1250
1251     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1252     spiSendData[1] = 0x22;
1253     SPI_send_data(2, spiSendData);
1254
1255     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1256     spiSendData[1] = 0x7A;
1257     SPI_send_data(2, spiSendData);
1258 }break;
1259
1260 }
1261
1262 // Calibrate when going from IDLE to RX or TX, Crystal off when in SLEEP state
1263 spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM0;
1264 spiSendData[1] = 0x10;
1265 SPI_send_data(2, spiSendData);
1266
1267 // FCL gain: 3000, Saturation point for the frequency offset compensation algorithm -> SmartRF Studio
1268 spiSendData[0] = CC1101_CR_FOCCFG;
1269 spiSendData[1] = 0x16;
1270 SPI_send_data(2, spiSendData);
1271
1272 // 10 dBm output power
1273 spiSendData[0] = 0x7E;
1274 spiSendData[1] = 0x12;

```

```

1275     spiSendData[2] = 0xc0;
1276     SPI_send_data(3, spiSendData);
1277
1278     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND0;
1279     spiSendData[1] = 0x11;
1280     SPI_send_data(2, spiSendData);
1281 }
1282
1283 void cc1101_config_burst_tx(void) {
1284     uint32_t spiSendData[3];
1285
1286     // GDO2 Output Pin Configuration 2
1287     // 0x2E -> High impedance (3-state)
1288     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG2;
1289     spiSendData[1] = 0x2E;
1290     SPI_send_data(2, spiSendData);
1291
1292     // GDO0 Output Pin Configuration 0
1293     // 0x2E -> High impedance (3-state)
1294     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG0;
1295     spiSendData[1] = 0x2E;
1296     SPI_send_data(2, spiSendData);
1297
1298     // Asynchronous serial mode, Infinite packet length mode
1299     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;
1300     spiSendData[1] = 0x32;
1301     SPI_send_data(2, spiSendData);
1302
1303     // Channel Number
1304     spiSendData[0] = CC1101_CR_CHANNR;
1305     spiSendData[1] = 0x00;
1306     SPI_send_data(2, spiSendData);
1307
1308     // Carrier frequency
1309     spiSendData[0] = CC1101_CR_FSCTRL0;
1310     spiSendData[1] = 0x06;
1311     SPI_send_data(2, spiSendData);
1312
1313     // Frequency Control Word, High Byte
1314     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ2;
1315     spiSendData[1] = 0x10;
1316     SPI_send_data(2, spiSendData);
1317
1318     // Frequency Control Word, Middle Byte
1319     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ1;
1320     spiSendData[1] = 0xB1;
1321     SPI_send_data(2, spiSendData);
1322
1323     // Frequency Control Word, LOW Byte
1324     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ0;
1325     spiSendData[1] = 0x3B;
1326     SPI_send_data(2, spiSendData);
1327
1328     /******
1329     // Modem Configuration 4
1330     // 250kBaud -> 0xD
1331     // RX Filter 58.035714 -> 0xFx
1332     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1333     spiSendData[1] = 0xFD;
1334     SPI_send_data(2, spiSendData);
1335
1336     // Modem Configuration 3
1337     // 250kBaud -> 0x3B
1338     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1339     spiSendData[1] = 0x3B;
1340     SPI_send_data(2, spiSendData);
1341
1342     // Modem Configuration 2
1343     // OOK -> 0x30
1344     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1345     spiSendData[1] = 0x30;
1346     SPI_send_data(2, spiSendData);
1347
1348     // Modem Configuration 1
1349     // Channel spacing 199.951172kHz -> 0x22
1350     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1351     spiSendData[1] = 0x00;
1352     SPI_send_data(2, spiSendData);
1353
1354     /******
1355     // Modem Deviation Setting
1356     spiSendData[0] = CC1101_CR_DEVIATN;
1357     spiSendData[1] = 0x15;
1358     SPI_send_data(2, spiSendData);
1359

```

```

1360 // Main Radio Control State Machine Configuration 0
1361 spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM0;
1362 spiSendData[1] = 0x18;
1363 SPI_send_data(2, spiSendData);
1364
1365 // Frequency Offset Compensation Configuration
1366 spiSendData[0] = CC1101_CR_FOCCFG;
1367 spiSendData[1] = 0x16;
1368 SPI_send_data(2, spiSendData);
1369
1370 // 10 dBm output power
1371 spiSendData[0] = 0x7E;
1372 spiSendData[1] = 0x12;
1373 spiSendData[2] = 0xc0;
1374 SPI_send_data(3, spiSendData);
1375
1376 spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND0;
1377 spiSendData[1] = 0x11;
1378 SPI_send_data(2, spiSendData);
1379
1380 }
1381
1382 void cc1101_config_cali_burst(void) {
1383     uint32_t spiSendData[3];
1384
1385     // GDO2 Output Pin Configuration 2
1386     // 0x2E -> High impedance (3-state)
1387     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG2;
1388     spiSendData[1] = 0x2E;
1389     SPI_send_data(2, spiSendData);
1390
1391     // GDO0 Output Pin Configuration 0
1392     // 0x2E -> High impedance (3-state)
1393     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG0;
1394     spiSendData[1] = 0x2E;
1395     SPI_send_data(2, spiSendData);
1396
1397     // Asynchronous serial mode, Infinite packet length mode
1398     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;
1399     spiSendData[1] = 0x32;
1400     SPI_send_data(2, spiSendData);
1401
1402     // Channel Number
1403     spiSendData[0] = CC1101_CR_CHANNR;
1404     spiSendData[1] = 0x00;
1405     SPI_send_data(2, spiSendData);
1406
1407     // Carrier frequency
1408     spiSendData[0] = CC1101_CR_FSCTRL0;
1409     spiSendData[1] = 0x06;
1410     SPI_send_data(2, spiSendData);
1411
1412     // Frequency Control Word, High Byte
1413     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ2;
1414     spiSendData[1] = 0x10;
1415     SPI_send_data(2, spiSendData);
1416
1417     // Frequency Control Word, Middle Byte
1418     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ1;
1419     spiSendData[1] = 0xB1;
1420     SPI_send_data(2, spiSendData);
1421
1422     // Frequency Control Word, LOW Byte
1423     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ0;
1424     spiSendData[1] = 0x3B;
1425     SPI_send_data(2, spiSendData);
1426
1427     /******
1428     // Modem Configuration 4
1429     // 250kBaud -> 0xD
1430     // RX Filter 58.035714 -> 0xFx
1431     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1432     spiSendData[1] = 0xFD;
1433     SPI_send_data(2, spiSendData);
1434
1435     // Modem Configuration 3
1436     // 250kBaud -> 0x3B
1437     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1438     spiSendData[1] = 0x3B;
1439     SPI_send_data(2, spiSendData);
1440
1441     // Modem Configuration 2
1442     // OOK -> 0x30
1443     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1444     spiSendData[1] = 0x30;

```

```
1445     SPI_send_data(2, spiSendData);
1446
1447     // Modem Configuration 1
1448     // Channel spacing 199.951172kHz -> 0x22
1449     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;
1450     spiSendData[1] = 0x00;
1451     SPI_send_data(2, spiSendData);
1452
1453     /******
1454     // Modem Deviation Setting
1455     spiSendData[0] = CC1101_CR_DEVIATN;
1456     spiSendData[1] = 0x15;
1457     SPI_send_data(2, spiSendData);
1458
1459     // Main Radio Control State Machine Configuration 0
1460     spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM0;
1461     spiSendData[1] = 0x18;
1462     SPI_send_data(2, spiSendData);
1463
1464     // Frequency Offset Compensation Configuration
1465     spiSendData[0] = CC1101_CR_FOCCFG;
1466     spiSendData[1] = 0x16;
1467     SPI_send_data(2, spiSendData);
1468
1469     // 10 dBm output power
1470     spiSendData[0] = 0x7E;
1471     spiSendData[1] = 0x12;
1472     spiSendData[2] = 0xc0;
1473     SPI_send_data(3, spiSendData);
1474
1475     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND0;
1476     spiSendData[1] = 0x11;
1477     SPI_send_data(2, spiSendData);
1478
1479 }
1480
1481 void cc1101_config_burst_rx(void) {
1482     uint32_t spiSendData[3];
1483
1484     // GDO2 Output Pin Configuration 2
1485     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG2;
1486     spiSendData[1] = 0x0D;
1487     SPI_send_data(2, spiSendData);
1488
1489     // GDO2 Output Pin Configuration 1
1490     // 0x2E -> High impedance (3-state)
1491     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG1;
1492     spiSendData[1] = 0x2E;
1493     SPI_send_data(2, spiSendData);
1494
1495     // GDO1 Output Pin Configuration 0
1496     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG0;
1497     spiSendData[1] = 0x36;
1498     SPI_send_data(2, spiSendData);
1499
1500     // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
1501     spiSendData[0] = CC1101_CR_FIFOTHR;
1502     spiSendData[1] = 0x47;
1503     SPI_send_data(2, spiSendData);
1504
1505     // Asynchronous serial mode, Infinite packet length mode
1506     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;
1507     spiSendData[1] = 0x32;
1508     SPI_send_data(2, spiSendData);
1509
1510     // Carrier frequency
1511     spiSendData[0] = CC1101_CR_FSCTRL1;
1512     spiSendData[1] = 0x06;
1513     SPI_send_data(2, spiSendData);
1514
1515     // Frequency Control Word, High Byte
1516     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ2;
1517     spiSendData[1] = 0x10;
1518     SPI_send_data(2, spiSendData);
1519
1520     // Frequency Control Word, Middle Byte
1521     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ1;
1522     spiSendData[1] = 0xB1;
1523     SPI_send_data(2, spiSendData);
1524
1525     // Frequency Control Word, LOW Byte
1526     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ0;
1527     spiSendData[1] = 0x3B;
1528     SPI_send_data(2, spiSendData);
1529 }
```



```
1530  /******  
1531  // Modem Configuration 4  
1532  // 250kBaud -> 0xD  
1533  // RX Filter 58.035714 -> 0xFx  
1534  spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;  
1535  spiSendData[1] = 0x5D;  
1536  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1537  
1538  // Modem Configuration 3  
1539  // 250kBaud -> 0x3B  
1540  spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;  
1541  spiSendData[1] = 0x3B;  
1542  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1543  
1544  // Modem Configuration 2  
1545  // OOK -> 0x30  
1546  spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;  
1547  spiSendData[1] = 0x30;  
1548  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1549  
1550  // Modem Configuration 1  
1551  // Channel spacing 199.951172kHz -> 0x22  
1552  spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG1;  
1553  spiSendData[1] = 0x22;  
1554  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1555  
1556  // Modem Configuration 0  
1557  spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;  
1558  spiSendData[1] = 0xF8;  
1559  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1560  
1561  /******  
1562  // Modem Deviation Setting  
1563  spiSendData[0] = CC1101_CR_DEVIATN;  
1564  spiSendData[1] = 0x15;  
1565  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1566  
1567  // Main Radio Control State Machine Configuration 2  
1568  spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM2;  
1569  spiSendData[1] = 0x07;  
1570  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1571  
1572  // Main Radio Control State Machine Configuration 1  
1573  spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM1;  
1574  spiSendData[1] = 0x30;  
1575  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1576  
1577  // Main Radio Control State Machine Configuration 0  
1578  spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM0;  
1579  spiSendData[1] = 0x18;  
1580  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1581  
1582  // Frequency Offset Compensation Configuration  
1583  spiSendData[0] = CC1101_CR_FOCCFG;  
1584  spiSendData[1] = 0x16;  
1585  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1586  
1587  // Bit Synchronization Configuration  
1588  spiSendData[0] = CC1101_CR_BSCFG;  
1589  spiSendData[1] = 0x6C;  
1590  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1591  
1592  // AGCCTRL2  
1593  spiSendData[0] = CC1101_CR_AGCCTRL2;  
1594  spiSendData[1] = 0x03;  
1595  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1596  
1597  // AGCCTRL1  
1598  spiSendData[0] = CC1101_CR_AGCCTRL1;  
1599  spiSendData[1] = 0x40;  
1600  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1601  
1602  // AGCCTRL0  
1603  spiSendData[0] = CC1101_CR_AGCCTRL0;  
1604  spiSendData[1] = 0x91;  
1605  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1606  
1607  // Wake On Radio Control  
1608  spiSendData[0] = CC1101_CR_WORCTRL;  
1609  spiSendData[1] = 0x8F;  
1610  SPI_send_data(2, spiSendData);  
1611  
1612  // Front End RX Configuration 1  
1613  spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND1;  
1614  spiSendData[1] = 0x56;
```

```
1615     SPI_send_data(2, spiSendData);
1616
1617     // Front End RX Configuration 0
1618     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND0;
1619     spiSendData[1] = 0x11;
1620     SPI_send_data(2, spiSendData);
1621
1622     // 10 dBm output power
1623     spiSendData[0] = 0x7E;
1624     spiSendData[1] = 0x12;
1625     spiSendData[2] = 0xc0;
1626     SPI_send_data(3, spiSendData);
1627 }
1628
1629 void cc1101_config_burst_cali(void) {
1630     uint32_t spiSendData[3];
1631
1632     // GDO2 Output Pin Configuration 2
1633     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG2;
1634     spiSendData[1] = 0x0D;
1635     SPI_send_data(2, spiSendData);
1636
1637     // GDO0 Output Pin Configuration 0
1638     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG0;
1639     spiSendData[1] = 0x2E;
1640     SPI_send_data(2, spiSendData);
1641
1642     // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
1643     // RX Attenuation 18dB -> 0x77
1644     // RX Attenuation 12dB -> 0x67
1645     // RX Attenuation 6dB -> 0x57
1646     // RX Attenuation 0dB -> 0x47
1647     spiSendData[0] = CC1101_CR_FIFOTHR;
1648     spiSendData[1] = 0x47;
1649     SPI_send_data(2, spiSendData);
1650
1651     // Asynchronous serial mode, Infinite packet length mode
1652     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;
1653     spiSendData[1] = 0x32;
1654     SPI_send_data(2, spiSendData);
1655
1656     // Frequency Synthesizer Control 1
1657     spiSendData[0] = CC1101_CR_FSCTRL1;
1658     spiSendData[1] = 0x06;
1659     SPI_send_data(2, spiSendData);
1660
1661     // Frequency Control Word, High Byte
1662     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ2;
1663     spiSendData[1] = 0x10;
1664     SPI_send_data(2, spiSendData);
1665
1666     // Frequency Control Word, Middle Byte
1667     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ1;
1668     spiSendData[1] = 0xB1;
1669     SPI_send_data(2, spiSendData);
1670
1671     // Frequency Control Word, LOW Byte
1672     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ0;
1673     spiSendData[1] = 0x3B;
1674     SPI_send_data(2, spiSendData);
1675
1676     /*****
1677     // Modem Configuration 4
1678     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1679     spiSendData[1] = 0x5D;
1680     SPI_send_data(2, spiSendData);
1681
1682     // Modem Configuration 3
1683     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1684     spiSendData[1] = 0x3B;
1685     SPI_send_data(2, spiSendData);
1686
1687     // Modem Configuration 2
1688     // OOK -> 0x30
1689     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1690     spiSendData[1] = 0x30;
1691     SPI_send_data(2, spiSendData);
1692
1693     // Modem Configuration 0
1694     // Channel spacing 199.951172kHz -> 0xF8
1695     spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG0;
1696     spiSendData[1] = 0xF8;
1697     SPI_send_data(2, spiSendData);
1698
1699     *****/
```

```
1700
1701 // Modem Deviation Setting
1702 spiSendData[0] = CC1101_CR_DEVIATN;
1703 spiSendData[1] = 0x15;
1704 SPI_send_data(2, spiSendData);
1705
1706 // Main Radio Control State Machine Configuration 1
1707 spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM1;
1708 spiSendData[1] = 0x07;
1709 SPI_send_data(2, spiSendData);
1710
1711 // Main Radio Control State Machine Configuration 0
1712 spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM0;
1713 spiSendData[1] = 0x18;
1714 SPI_send_data(2, spiSendData);
1715
1716 // Frequency Offset Compensation Configuration
1717 spiSendData[0] = CC1101_CR_FOCCFG;
1718 spiSendData[1] = 0x16;
1719 SPI_send_data(2, spiSendData);
1720
1721 // Bit Synchronization Configuration
1722 spiSendData[0] = CC1101_CR_BSCFG;
1723 spiSendData[1] = 0x6C;
1724 SPI_send_data(2, spiSendData);
1725
1726 // Wake On Radio Control
1727 spiSendData[0] = CC1101_CR_WORCTRL;
1728 spiSendData[1] = 0x8F;
1729 SPI_send_data(2, spiSendData);
1730
1731 // Front End RX Configuration 1
1732 spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND1;
1733 spiSendData[1] = 0x56;
1734 SPI_send_data(2, spiSendData);
1735
1736 // Front End RX Configuration 0
1737 spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND0;
1738 spiSendData[1] = 0x11;
1739 SPI_send_data(2, spiSendData);
1740
1741 // 10 dBm output power
1742 spiSendData[0] = 0x7E;
1743 spiSendData[1] = 0x00;
1744 spiSendData[2] = 0x60;
1745 SPI_send_data(3, spiSendData);
1746 }
1747
1748 void cc1101_config_calb_clk(void) {
1749     uint32_t spiSendData[3];
1750
1751     // GDO2 Output Pin Configuration 2
1752     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG2;
1753     spiSendData[1] = 0x0D;
1754     SPI_send_data(2, spiSendData);
1755
1756     // GDO0 Output Pin Configuration 0
1757     spiSendData[0] = CC1101_CR_IOCFG0;
1758     spiSendData[1] = 0x2E;
1759     SPI_send_data(2, spiSendData);
1760
1761     // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
1762     // RX Attenuation 18dB -> 0x77
1763     // RX Attenuation 12dB -> 0x67
1764     // RX Attenuation 6dB -> 0x57
1765     // RX Attenuation 0dB -> 0x47
1766     spiSendData[0] = CC1101_CR_FIFOTHR;
1767     spiSendData[1] = 0x47;
1768     SPI_send_data(2, spiSendData);
1769
1770     // Asynchronous serial mode, Infinite packet length mode
1771     spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTCTRL0;
1772     spiSendData[1] = 0x32;
1773     SPI_send_data(2, spiSendData);
1774
1775     // Frequency Synthesizer Control 1
1776     spiSendData[0] = CC1101_CR_FSCTRL1;
1777     spiSendData[1] = 0x06;
1778     SPI_send_data(2, spiSendData);
1779
1780     // Frequency Control Word, High Byte
1781     spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ2;
1782     spiSendData[1] = 0x10;
1783     SPI_send_data(2, spiSendData);
1784
```

```

1785 // Frequency Control Word, Middle Byte
1786 spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ1;
1787 spiSendData[1] = 0xB1;
1788 SPI_send_data(2, spiSendData);
1789
1790 //Frequency Control Word, LOW Byte
1791 spiSendData[0] = CC1101_CR_FREQ0;
1792 spiSendData[1] = 0x3B;
1793 SPI_send_data(2, spiSendData);
1794
1795 /*****
1796 // Modem Configuration 4
1797 spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG4;
1798 spiSendData[1] = 0x5D;
1799 SPI_send_data(2, spiSendData);
1800
1801 // Modem Configuration 3
1802 spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG3;
1803 spiSendData[1] = 0x3B;
1804 SPI_send_data(2, spiSendData);
1805
1806 // Modem Configuration 2
1807 // OOK -> 0x30
1808 spiSendData[0] = CC1101_CR_MDMCFG2;
1809 spiSendData[1] = 0x30;
1810 SPI_send_data(2, spiSendData);
1811
1812 /*****
1813
1814 // Modem Deviation Setting
1815 spiSendData[0] = CC1101_CR_DEVIATN;
1816 spiSendData[1] = 0x15;
1817 SPI_send_data(2, spiSendData);
1818
1819 // Main Radio Control State Machine Configuration 1
1820 spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM1;
1821 spiSendData[1] = 0x0B;
1822 SPI_send_data(2, spiSendData);
1823
1824 // Main Radio Control State Machine Configuration 0
1825 spiSendData[0] = CC1101_CR_MCSM0;
1826 spiSendData[1] = 0x18;
1827 SPI_send_data(2, spiSendData);
1828
1829 // Frequency Offset Compensation Configuration
1830 spiSendData[0] = CC1101_CR_FOCCFG;
1831 spiSendData[1] = 0x16;
1832 SPI_send_data(2, spiSendData);
1833
1834 // Wake On Radio Control
1835 spiSendData[0] = CC1101_CR_WORCTRL;
1836 spiSendData[1] = 0x8F;
1837 SPI_send_data(2, spiSendData);
1838
1839 // Front End RX Configuration 0
1840 spiSendData[0] = CC1101_CR_FREND0;
1841 spiSendData[1] = 0x11;
1842 SPI_send_data(2, spiSendData);
1843
1844 // 10 dBm output power
1845 spiSendData[0] = 0x7E;
1846 spiSendData[1] = 0x12;
1847 spiSendData[2] = 0xc0;
1848 SPI_send_data(3, spiSendData);
1849 }
1850
1851 void wakeup(void) {
1852     cc1101_power_up_reset();
1853     cc1101_reset();
1854     cc1101_config_burst_tx();
1855     cc1101_tx_asynchronous_mode();
1856     delay_ms(1000);
1857 }
1858
1859 void cc1101_clear_rx_fifo(void) {
1860     uint32_t spiSendData[1];
1861
1862     // DATA packet length
1863     spiSendData[0] = CC1101_CS_SFRX;
1864     SPI_send_data(1, spiSendData);
1865 }
1866
1867 void cc1101_rx(uint8_t packages_to_rx) {
1868     uint32_t spiSendData[2];
1869

```

```
1870 // DATA packet length
1871 spiSendData[0] = CC1101_CR_PKTLEN;
1872 spiSendData[1] = packages_to_rx;
1873 SPI_send_data(2, spiSendData);
1874
1875 // Enable CRC check when receiving data
1876 cc1101_enable_crc();
1877
1878 // Clear RX FIFO
1879 cc1101_clear_rx_fifo();
1880
1881 // RX state
1882 spiSendData[0] = CC1101_CS_SRX;
1883 SPI_send_data(1, spiSendData);
1884
1885 }
```

```
1  /*****
2  **   File name       : convert.c
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 14/09/2014
5  **   Last Update    : 27/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : Convert function
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/main.h"
28 #include "header/uart.h"
29 #include "header/spi.h"
30 #include "header/timer.h"
31 #include "header/interrupts.h"
32 #include "header/CC1101.h"
33 #include "header/gpio.h"
34 #include "header/convert.h"
35
36 uint8_t char_to_int(char character) {
37     uint8_t value = 0x00;
38
39     if(character == 0x30) {
40         value = 0;
41     } else if(character == 0x31) {
42         value = 1;
43     } else if(character == 0x32) {
44         value = 2;
45     } else if(character == 0x33) {
46         value = 3;
47     } else if(character == 0x34) {
48         value = 4;
49     } else if(character == 0x35) {
50         value = 5;
51     } else if(character == 0x36) {
52         value = 6;
53     } else if(character == 0x37) {
54         value = 7;
55     } else if(character == 0x38) {
56         value = 8;
57     } else if(character == 0x39) {
58         value = 9;
59     }
60
61     return value;
62 }
63
64 uint8_t char_to_int2(char character, char character2) {
65     uint8_t value = 0x00;
66
67     if(character == 0x30) {
68         value = 0;
69     } else if(character == 0x31) {
70         value = 10;
71     } else if(character == 0x32) {
72         value = 20;
73     } else if(character == 0x33) {
74         value = 30;
75     } else if(character == 0x34) {
76         value = 40;
77     } else if(character == 0x35) {
78         value = 50;
79     } else if(character == 0x36) {
80         value = 60;
81     } else if(character == 0x37) {
82         value = 70;
83     } else if(character == 0x38) {
84         value = 80;
85     } else if(character == 0x39) {
```

```
86     value = 90;
87 }
88
89 if(character2 == 0x30) {
90     value = value + 0;
91 } else if(character2 == 0x31) {
92     value = value + 1;
93 } else if(character2 == 0x32) {
94     value = value + 2;
95 } else if(character2 == 0x33) {
96     value = value + 3;
97 } else if(character2 == 0x34) {
98     value = value + 4;
99 } else if(character2 == 0x35) {
100    value = value + 5;
101 } else if(character2 == 0x36) {
102    value = value + 6;
103 } else if(character2 == 0x37) {
104    value = value + 7;
105 } else if(character2 == 0x38) {
106    value = value + 8;
107 } else if(character2 == 0x39) {
108    value = value + 9;
109 }
110
111 return value;
112 }
113
114 uint8_t char_to_int3(char character, char character2, char character3) {
115     uint8_t value = 0x00;
116
117     if(character == 0x30) {
118         value = 000;
119     } else if(character == 0x31) {
120         value = 100;
121     } else if(character == 0x32) {
122         value = 200;
123     }
124
125     if(character2 == 0x30) {
126         value = value + 00;
127     } else if(character2 == 0x31) {
128         value = value + 10;
129     } else if(character2 == 0x32) {
130         value = value + 20;
131     } else if(character2 == 0x33) {
132         value = value + 30;
133     } else if(character2 == 0x34) {
134         value = value + 40;
135     } else if(character2 == 0x35) {
136         value = value + 50;
137     } else if(character2 == 0x36) {
138         value = value + 60;
139     } else if(character2 == 0x37) {
140         value = value + 70;
141     } else if(character2 == 0x38) {
142         value = value + 80;
143     } else if(character2 == 0x39) {
144         value = value + 90;
145     }
146
147     if(character3 == 0x30) {
148         value = value + 0;
149     } else if(character3 == 0x31) {
150         value = value + 1;
151     } else if(character3 == 0x32) {
152         value = value + 2;
153     } else if(character3 == 0x33) {
154         value = value + 3;
155     } else if(character3 == 0x34) {
156         value = value + 4;
157     } else if(character3 == 0x35) {
158         value = value + 5;
159     } else if(character3 == 0x36) {
160         value = value + 6;
161     } else if(character3 == 0x37) {
162         value = value + 7;
163     } else if(character3 == 0x38) {
164         value = value + 8;
165     } else if(character3 == 0x39) {
166         value = value + 9;
167     }
168     return value;
169 }
170
```

```
171 uint8_t char_to_hex(char character1, char character2) {
172     uint8_t hex = 0x00;
173
174     if(character1 == 0x30) {
175         hex = 0x00 << 4;
176     } else if(character1 == 0x31) {
177         hex = 0x01 << 4;
178     } else if(character1 == 0x32) {
179         hex = 0x02 << 4;
180     } else if(character1 == 0x33) {
181         hex = 0x03 << 4;
182     } else if(character1 == 0x34) {
183         hex = 0x04 << 4;
184     } else if(character1 == 0x35) {
185         hex = 0x05 << 4;
186     } else if(character1 == 0x36) {
187         hex = 0x06 << 4;
188     } else if(character1 == 0x37) {
189         hex = 0x07 << 4;
190     } else if(character1 == 0x38) {
191         hex = 0x08 << 4;
192     } else if(character1 == 0x39) {
193         hex = 0x09 << 4;
194     } else if(character1 == 0x61) {
195         hex = 0x0a << 4;
196     } else if(character1 == 0x62) {
197         hex = 0x0b << 4;
198     } else if(character1 == 0x63) {
199         hex = 0x0c << 4;
200     } else if(character1 == 0x64) {
201         hex = 0x0d << 4;
202     } else if(character1 == 0x65) {
203         hex = 0x0e << 4;
204     } else if(character1 == 0x66) {
205         hex = 0x0f << 4;
206     } else if(character1 == 0x41) {
207         hex = 0x0A << 4;
208     } else if(character1 == 0x42) {
209         hex = 0x0B << 4;
210     } else if(character1 == 0x43) {
211         hex = 0x0C << 4;
212     } else if(character1 == 0x44) {
213         hex = 0x0D << 4;
214     } else if(character1 == 0x45) {
215         hex = 0x0E << 4;
216     } else if(character1 == 0x46) {
217         hex = 0x0F << 4;
218     }
219
220     if(character2 == 0x30) {
221         hex |= 0x00 << 0;
222     } else if(character2 == 0x31) {
223         hex |= 0x01 << 0;
224     } else if(character2 == 0x32) {
225         hex |= 0x02 << 0;
226     } else if(character2 == 0x33) {
227         hex |= 0x03 << 0;
228     } else if(character2 == 0x34) {
229         hex |= 0x04 << 0;
230     } else if(character2 == 0x35) {
231         hex |= 0x05 << 0;
232     } else if(character2 == 0x36) {
233         hex |= 0x06 << 0;
234     } else if(character2 == 0x37) {
235         hex |= 0x07 << 0;
236     } else if(character2 == 0x38) {
237         hex |= 0x08 << 0;
238     } else if(character2 == 0x39) {
239         hex |= 0x09 << 0;
240     } else if(character2 == 0x61) {
241         hex |= 0x0a << 0;
242     } else if(character2 == 0x62) {
243         hex |= 0x0b << 0;
244     } else if(character2 == 0x63) {
245         hex |= 0x0c << 0;
246     } else if(character2 == 0x64) {
247         hex |= 0x0d << 0;
248     } else if(character2 == 0x65) {
249         hex |= 0x0e << 0;
250     } else if(character2 == 0x66) {
251         hex |= 0x0f << 0;
252     } else if(character2 == 0x41) {
253         hex |= 0x0A << 0;
254     } else if(character2 == 0x42) {
255         hex |= 0x0B << 0;
```



```
256     } else if(character2 == 0x43) {
257         hex |=0x0C << 0;
258     } else if(character2 == 0x44) {
259         hex |=0x0D << 0;
260     } else if(character2 == 0x45) {
261         hex |=0x0E << 0;
262     } else if(character2 == 0x46) {
263         hex |=0x0F << 0;
264     }
265
266     return hex;
267 }
268
269 uint16_t char_to_hex3(char character1, char character2, char character3) {
270     uint16_t hex = 0x0000;
271
272     if(character1 == 0x30) {
273         hex = 0x00 << 8;
274     } else if(character1 == 0x31) {
275         hex = 0x01 << 8;
276     } else if(character1 == 0x32) {
277         hex = 0x02 << 8;
278     } else if(character1 == 0x33) {
279         hex = 0x03 << 8;
280     } else if(character1 == 0x34) {
281         hex = 0x04 << 8;
282     } else if(character1 == 0x35) {
283         hex = 0x05 << 8;
284     } else if(character1 == 0x36) {
285         hex = 0x06 << 8;
286     } else if(character1 == 0x37) {
287         hex = 0x07 << 8;
288     } else if(character1 == 0x38) {
289         hex = 0x08 << 8;
290     } else if(character1 == 0x39) {
291         hex = 0x09 << 8;
292     } else if(character1 == 0x61) {
293         hex = 0x0a << 8;
294     } else if(character1 == 0x62) {
295         hex = 0x0b << 8;
296     } else if(character1 == 0x63) {
297         hex = 0x0c << 8;
298     } else if(character1 == 0x64) {
299         hex = 0x0d << 8;
300     } else if(character1 == 0x65) {
301         hex = 0x0e << 8;
302     } else if(character1 == 0x66) {
303         hex = 0x0f << 8;
304     } else if(character1 == 0x41) {
305         hex = 0x0A << 8;
306     } else if(character1 == 0x42) {
307         hex = 0x0B << 8;
308     } else if(character1 == 0x43) {
309         hex = 0x0C << 8;
310     } else if(character1 == 0x44) {
311         hex = 0x0D << 8;
312     } else if(character1 == 0x45) {
313         hex = 0x0E << 8;
314     } else if(character1 == 0x46) {
315         hex = 0x0F << 8;
316     }
317
318     if(character2 == 0x30) {
319         hex |=0x00 << 4;
320     } else if(character2 == 0x31) {
321         hex |=0x01 << 4;
322     } else if(character2 == 0x32) {
323         hex |=0x02 << 4;
324     } else if(character2 == 0x33) {
325         hex |=0x03 << 4;
326     } else if(character2 == 0x34) {
327         hex |=0x04 << 4;
328     } else if(character2 == 0x35) {
329         hex |=0x05 << 4;
330     } else if(character2 == 0x36) {
331         hex |=0x06 << 4;
332     } else if(character2 == 0x37) {
333         hex |=0x07 << 4;
334     } else if(character2 == 0x38) {
335         hex |=0x08 << 4;
336     } else if(character2 == 0x39) {
337         hex |=0x09 << 4;
338     } else if(character2 == 0x61) {
339         hex |=0x0a << 4;
340     } else if(character2 == 0x62) {
```

```
341     hex |=0x0b << 4;
342 } else if(character2 == 0x63) {
343     hex |=0x0c << 4;
344 } else if(character2 == 0x64) {
345     hex |=0x0d << 4;
346 } else if(character2 == 0x65) {
347     hex |=0x0e << 4;
348 } else if(character2 == 0x66) {
349     hex |=0x0f << 4;
350 } else if(character2 == 0x41) {
351     hex |=0x0A << 4;
352 } else if(character2 == 0x42) {
353     hex |=0x0B << 4;
354 } else if(character2 == 0x43) {
355     hex |=0x0C << 4;
356 } else if(character2 == 0x44) {
357     hex |=0x0D << 4;
358 } else if(character2 == 0x45) {
359     hex |=0x0E << 4;
360 } else if(character2 == 0x46) {
361     hex |=0x0F << 4;
362 }
363
364 if(character3 == 0x30) {
365     hex |=0x00 << 0;
366 } else if(character3 == 0x31) {
367     hex |=0x01 << 0;
368 } else if(character3 == 0x32) {
369     hex |=0x02 << 0;
370 } else if(character3 == 0x33) {
371     hex |=0x03 << 0;
372 } else if(character3 == 0x34) {
373     hex |=0x04 << 0;
374 } else if(character3 == 0x35) {
375     hex |=0x05 << 0;
376 } else if(character3 == 0x36) {
377     hex |=0x06 << 0;
378 } else if(character3 == 0x37) {
379     hex |=0x07 << 0;
380 } else if(character3 == 0x38) {
381     hex |=0x08 << 0;
382 } else if(character3 == 0x39) {
383     hex |=0x09 << 0;
384 } else if(character3 == 0x61) {
385     hex |=0x0a << 0;
386 } else if(character3 == 0x62) {
387     hex |=0x0b << 0;
388 } else if(character3 == 0x63) {
389     hex |=0x0c << 0;
390 } else if(character3 == 0x64) {
391     hex |=0x0d << 0;
392 } else if(character3 == 0x65) {
393     hex |=0x0e << 0;
394 } else if(character3 == 0x66) {
395     hex |=0x0f << 0;
396 } else if(character3 == 0x41) {
397     hex |=0x0A << 0;
398 } else if(character3 == 0x42) {
399     hex |=0x0B << 0;
400 } else if(character3 == 0x43) {
401     hex |=0x0C << 0;
402 } else if(character3 == 0x44) {
403     hex |=0x0D << 0;
404 } else if(character3 == 0x45) {
405     hex |=0x0E << 0;
406 } else if(character3 == 0x46) {
407     hex |=0x0F << 0;
408 }
409
410 return hex;
411 }
```

```

1  /*****
2  **   File name       : gpio.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 08/08/2014
5  **   Last Update    : 27/07/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : GPIO Functions
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/uart.h"
28 #include "header/spi.h"
29 #include "header/timer.h"
30 #include "header/interrupts.h"
31 #include "header/CC1101.h"
32 #include "header/gpio.h"
33
34
35 void GPIOinit() {
36     // Enable the GPIO port that is used for the on-board LEDs.
37     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
38     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
39     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
40     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
41     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOM);
42     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ);
43
44     // Current Sensor
45     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_4);
46     ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF);
47
48     // Testpin
49     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4);
50     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2);
51     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4);
52
53     // Enable the GPIO pins for the LEDs.
54     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0);
55     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1);
56     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0);
57     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
58 }
59
60 void LED_test() {
61     LED0_ON;
62     delay_ms(100);
63     LED0_OFF;
64     LED1_ON;
65     delay_ms(100);
66     LED1_OFF;
67     LED2_ON;
68     delay_ms(100);
69     LED2_OFF;
70     LED3_ON;
71     delay_ms(100);
72     LED3_OFF;
73     RX_LED_ON;
74     delay_ms(100);
75     RX_LED_OFF;
76     TX_LED_ON;
77     delay_ms(100);
78     TX_LED_OFF;
79
80     RX_LED_ON;
81     delay_ms(100);
82     RX_LED_OFF;
83     LED3_ON;
84     delay_ms(100);
85     LED3_OFF;

```

---

```
86     LED2_ON;
87     delay_ms(100);
88     LED2_OFF;
89     LED1_ON;
90     delay_ms(100);
91     LED1_OFF;
92     LED0_ON;
93     delay_ms(100);
94     LED0_OFF;
95
96     delay_ms(100);
97 }
```

```

1  /*****
2  **   File name       : interrupts.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 16/05/2014
5  **   Last Update     : 27/07/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Interrupt function
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/adc.h"
17 #include "driverlib/gpio.h"
18 #include "driverlib/ssi.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/uart.h"
25 #include "driverlib/timer.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/main.h"
28 #include "header/interrupts.h"
29 #include "header/cc1101.h"
30 #include "header/gpio.h"
31 #include "header/timer.h"
32 #include "header/adc.h"
33 #include "header/LTC2376.h"
34 #include "header/AD7691.h"
35 #include "header/AD7176.h"
36
37 //*****
38 // System settings and clock rate
39 //*****
40 extern uint32_t g_ui32SysClock;
41 extern uint32_t delay_flag;
42 uint32_t g_ui32Flags;
43
44 //*****
45 // Communication states
46 //*****
47 extern uint8_t adress_this_station; // Adress of this Station
48
49 //*****
50 // Variables for the CC1101 communication
51 //*****
52 extern volatile uint8_t rx_data_length; // Number of expect packetes in the RX Mode
53 extern volatile uint8_t tx_data_length; // Number of packetes to send
54 extern volatile uint8_t rx_command; // Received command
55 extern volatile uint8_t rx_data[64]; // RX Data buffer
56 extern volatile uint8_t command_received_flag; // Flag for a command received
57
58 //*****
59 // Communication UART
60 //*****
61 extern volatile uint8_t rx_uart; // RX command
62 extern volatile uint8_t uart_rx_flag; // Flag for the UART
63 volatile unsigned char rx_char[31]; // UART data buffer
64
65 //*****
66 // Interrupt and communication flags
67 //*****
68 extern volatile uint8_t irq_mode; // Flag for the GDO2 mode
69 extern volatile uint8_t irq_send_done_flag; // Flag for send done
70 extern volatile uint8_t irq_cali_flag; // Flag for burat calibration
71 extern volatile uint8_t irq_timer0_mode; // Flag for the timer mode
72 extern volatile uint8_t irq_timer1_mode; // Flag for the timer1 mode
73 extern volatile uint8_t irq_delay_flag; // Flag for the delay timer
74 extern volatile uint8_t irq_timeout; // Flag for the time out timer
75
76 //*****
77 // Burst Mode
78 //*****
79 extern volatile uint8_t burst_freq; // Burst Frequency
80 extern volatile uint16_t asynch_counter; // Counts the TX trigger
81 extern volatile uint32_t burst_config; // Frequency time for the burst timer
82 extern volatile uint32_t burst_trigger_time; // Time (in us) for the burst trigger
83 extern volatile uint32_t burst_current[2000]; // Save the current date
84
85 //*****

```

```

86 // Clock calibration mode
87 //*****
88 extern volatile uint32_t clk_cal_i_counter; // Counter for the clock calibration
89 extern volatile uint32_t adc_value[50];
90 uint32_t value = 0; // Temp. value storage
91
92 //*****
93 // LTC2376-20 Test mode
94 // Data declaration for thesting LTC2376
95 // This can be deleted after testing the ADC
96 //*****
97 extern volatile uint8_t LTC2376_index;
98 extern volatile uint8_t LTC2376_count;
99 extern volatile uint32_t LTC2376_data[3]; // 24-bit data storage
100 extern volatile uint32_t LTC2376_asynch_counter;
101 extern volatile uint32_t LTC2376_values;
102 extern volatile uint32_t LTC2376_frequency_time;
103 extern volatile uint32_t LTC2376_value;
104 extern volatile uint32_t LTC2376_value_storage[40000];
105
106 //*****
107 // AD7691 Test mode
108 // Data declaration for thesting AD7691
109 // This can be deleted after testing the ADC
110 //*****
111 extern volatile uint8_t AD7691_index;
112 extern volatile uint8_t AD7691_count;
113 extern volatile uint32_t AD7691_data[2]; // 20-bit data storage
114 extern volatile uint32_t AD7691_asynch_counter;
115 extern volatile uint32_t AD7691_values;
116 extern volatile uint32_t AD7691_frequency_time;
117 extern volatile uint32_t AD7691_value;
118 extern volatile uint32_t AD7691_value_storage[2000];
119
120 //*****
121 // AD7176 Test mode
122 // Data declaration for thesting AD7176
123 // This can be deleted after testing the ADC
124 //*****
125 extern volatile uint8_t AD7176_index;
126 extern volatile uint8_t AD7176_count;
127 extern volatile uint32_t AD7176_data[3]; // 3*8bit data storage
128 extern volatile uint32_t AD7176_asynch_counter;
129 extern volatile uint32_t AD7176_values;
130 extern volatile uint32_t AD7176_frequency_time;
131 extern volatile uint32_t AD7176_value;
132 extern volatile uint32_t AD7176_value_storage[2000];
133
134 //*****
135 // The PortK interrupt handler, used for the communication with the CC1101
136 //*****
137 void PortKIntHandler(void) {
138     uint32_t status = 0xFFFF;
139     uint32_t ADC_buffer;
140
141     status = GPIOIntStatus(GPIO_PORTK_BASE, true);
142     GPIOIntClear(GPIO_PORTK_BASE, status);
143
144     switch(status) {
145         //*****
146         case GPIO_INT_PIN_0: break; // Interrupt on PortK0
147         //*****
148         case GPIO_INT_PIN_1: break; // Interrupt on PortK1
149         //*****
150         case GPIO_INT_PIN_2: break; // Interrupt on PortK2
151         //*****
152         case GPIO_INT_PIN_3: break; // Interrupt on PortK3
153         //*****
154         case GPIO_INT_PIN_4: break; // Interrupt on PortK4
155         //*****
156         case GPIO_INT_PIN_5: break; // Interrupt on PortK5
157         //*****
158         // Interrupt on GDO2 from CC1101 board
159         case GPIO_INT_PIN_6: // Interrupt on PortK6
160             // Clear the GDO2 interrupt
161             CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ;
162             CC1101_GDO2_IRQ_DISABLE;
163
164             //*** BEGIN DCO Calibration *****
165             if (IRQ_IS_GDO2_CLOCK_CALL_START) {
166                 TIMER2_START; // Start timer 2
167                 IRQ_SET_GDO2_CLOCK_CALL_END; // Switch to detect the end of the periode
168                 CC1101_GDO2_IRQ_ENABLE;
169             } else if (IRQ_IS_GDO2_CLOCK_CALL_END) {

```

```

171         adc_value[clk_cali_counter] = (g_ui32SysClock - ROM_TimerValueGet(TIMER2_BASE, TIMER_A));
172         if ((adc_value[clk_cali_counter]>200000) && (adc_value[clk_cali_counter]<290000)){ // noisfilter
173             clk_cali_counter++;
174         }
175
176         ROM_TimerDisable(TIMER2_BASE, TIMER_A);
177         TIMER2config(); // Timer to messure the triggerspace
178         IRQ_SET_GDO2_CLOCK_CALI_START;
179         CC1101_GDO2_IRQ_ENABLE;
180         /*** END DCO Calibration *****/
181
182     } else if (IRQ_IS_CALI_BURST) {
183         GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00); // Testpin
184         value = ROM_TimerValueGet(TIMER2_BASE, TIMER_A);
185         adc_value[0] = (g_ui32SysClock - value);
186         ROM_TimerDisable(TIMER2_BASE, TIMER_A);
187         RX_CALI_UNSET;
188
189     } else if (IRQ_IS_TX) {
190         TX_DONE_SET;
191         timeout_stop(); //Stop the timeout mode
192
193     } else if (IRQ_IS_RX) {
194         RX_LED_ON; // Turn the RX LED on
195
196         timeout_stop(); //Stop the timeout mode
197
198         rx_command = COMMAND_DOWNLINK_UNKOWN;
199
200         COMMAND_REVIVED_SET;
201
202         delay_ms(10);
203         //if (CC1101_GDO0_IS_HIGH) {
204
205             uint8_t rxbuf[64];
206
207             cc1101_read_rx_fifo(rxbuf, HEADER_LENGTH + rx_data_length);
208             //rx_data_length = 0; // Datenlänge wieder zurücksetzen
209
210             rx_command = rxbuf[1]; // Received Command
211
212             // Data packet for this station?
213             if (rxbuf[0] == address_this_station) {
214                 uint8_t index;
215                 for (index = 0; index < (HEADER_LENGTH + rx_data_length); index++) {
216                     rx_data[index] = rxbuf[index];
217                 }
218             }
219             //}
220             RX_LED_OFF; // Turn the RX LED off
221         }
222     }
223     break;
224     /***/
225     case GPIO_INT_PIN_7: // Interrupt on PortK0
226
227         if (TIMER1_MODE_IS_LTC2376) {
228             // Clear the LTC2376 interrupt
229             LTC2376_CLEAR_IRQ;
230             LTC2376_IRQ_DISABLE; // Disable the BUSY interrupt
231
232             // start to receive the data from the ADC
233             LTC2376_CS_ENABLE;
234
235             LTC2376_CNV_SET_LOW;
236
237             for (LTC2376_index = 0; LTC2376_index < LTC2376_count ; LTC2376_index++) {
238
239                 SSIDataPutNonBlocking (SSI3_BASE, 0x00);
240                 SSIDataGetNonBlocking (SSI3_BASE,&ADC_buffer);
241
242                 LTC2376_data[LTC2376_index] = ADC_buffer & 0xFF;
243
244                 // Wait untill SSI3 is ready
245                 while (SSIBusy (SSI3_BASE));
246             }
247
248             LTC2376_CS_DISABLE;
249
250             LTC2376_value = 0;
251
252             LTC2376_value = (LTC2376_data[0]) << 12;
253             LTC2376_value |= (LTC2376_data[1]& 0xFF) << 4 ;
254             LTC2376_value |= (LTC2376_data[2]& 0xFF) >> 4 ;
255
256             LTC2376_value_storage[LTC2376_asynch_counter] = LTC2376_value;

```

```

256         LTC2376_asynch_counter++; // Increment the sampling counter
257     }else if(TIMER1_MODE_IS_AD7691) {
258         AD7691_CLEAR_IRQ;
259         AD7691_IRQ_DISABLE;
260
261         delay_us(10);
262
263         for (AD7691_index = 0; AD7691_index < AD7691_count ; AD7691_index++) {
264             SSIDataPutNonBlocking (SSI3_BASE, 0x000);
265             SSIDataGetNonBlocking (SSI3_BASE,&ADC_buffer);
266
267             AD7691_data[AD7691_index] = ADC_buffer & 0x0FFF;
268         }
269
270         AD7691_CS_DISABLE;
271
272         AD7691_value = 0;
273
274         AD7691_value = (AD7691_data[0] & 0x1FF) << 9;
275         AD7691_value |= (AD7691_data[1] & 0x3FE) >> 1;
276
277         AD7691_value_storage[AD7691_asynch_counter] = 0xFFFF;
278         AD7691_value_storage[AD7691_asynch_counter] = AD7691_value;
279         AD7691_asynch_counter++; // Increment the sampling counter
280
281
282     }else if(TIMER1_MODE_IS_AD7176) {
283         AD7176_CLEAR_IRQ;
284         AD7176_IRQ_DISABLE;
285
286         // Readout the data from the ADC
287         for (AD7176_index = 0; AD7176_index < AD7176_count ; AD7176_index++) {
288             SSIDataPutNonBlocking (SSI3_BASE, 0x00);
289             SSIDataGetNonBlocking (SSI3_BASE,&ADC_buffer);
290
291             AD7176_data[AD7176_index] = ADC_buffer & 0xFF;
292
293             // Wait untill SSI3 is ready
294             while (SSIBusy (SSI3_BASE));
295         }
296
297         AD7176_CS_DISABLE;
298
299         AD7176_value = (AD7176_data[0] & 0xFF) << 16;
300         AD7176_value |= (AD7176_data[1] & 0xFF) << 8 ;
301         AD7176_value |= (AD7176_data[2] & 0xFF) << 0 ;
302
303         AD7176_value_storage[AD7176_asynch_counter] = AD7176_value;
304         AD7176_asynch_counter++; // Increment the sampling counter
305
306     }
307     break;
308     /*****
309     default: break; // Default case
310     */
311 }
312 }
313 }
314
315 /*****
316 // The UART interrupt handler for incoming characters
317 *****/
318 void UARTIntHandler(void) {
319     uint32_t ui32Status;
320     uint8_t index = 0;
321     uint8_t index2 = 0;
322
323     // Get the interrupt status.
324     ui32Status = ROM_UARTIntStatus(UART0_BASE, true);
325
326     // Clear the asserted interrupts.
327     ROM_UARTIntClear(UART0_BASE, ui32Status);
328
329     // Read characters untill the terminator CR
330     do{
331         rx_char[index] = UARTgetc(); //UARTCharGet(UART0_BASE);
332         index++;
333     }while (rx_char[index-1] != 0x0D);
334
335     /*****
336     // Detection the command "help"
337     *****/
338     if ((rx_char[0] == 0x68) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x6c) && (rx_char[3] == 0x70)) {
339         rx_uart = HELP;
340         uart_rx_flag = 1;

```



```

341
342 //*****
343 // Detection the command "get_voltage"
344 //*****
345 } else if ((rx_char[0] == 0x67) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
346           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x76) && (rx_char[5] == 0x6F) &&
347           (rx_char[6] == 0x6C) && (rx_char[7] == 0x74) && (rx_char[8] == 0x61) &&
348           (rx_char[9] == 0x67) && (rx_char[10] == 0x65)) {
349
350     rx_uart = GET_VOLTAGE;
351     uart_rx_flag = 1;
352 //*****
353 // Detection the command "get_goertzel"
354 //*****
355 } else if ((rx_char[0] == 0x67) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
356           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x67) && (rx_char[5] == 0x6F) &&
357           (rx_char[6] == 0x65) && (rx_char[7] == 0x72) && (rx_char[8] == 0x74) &&
358           (rx_char[9] == 0x7A) && (rx_char[10] == 0x65) && (rx_char[11] == 0x6C)) {
359
360     rx_uart = GET_GORTZEL;
361     uart_rx_flag = 1;
362 //*****
363 // Detection the command "send_hex()"
364 //*****
365 } else if ((rx_char[0] == 0x73) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x6E) &&
366           (rx_char[3] == 0x64) && (rx_char[4] == 0x5F) && (rx_char[5] == 0x68) &&
367           (rx_char[6] == 0x65) && (rx_char[7] == 0x78)) {
368
369     rx_uart = SEND_HEX;
370     uart_rx_flag = 1;
371 //*****
372 // Detection the command "set_proprocessing"
373 //*****
374 } else if ((rx_char[0] == 0x73) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
375           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x70) && (rx_char[5] == 0x72) &&
376           (rx_char[6] == 0x65) && (rx_char[7] == 0x70) && (rx_char[8] == 0x72) &&
377           (rx_char[9] == 0x6F) && (rx_char[10] == 0x63) && (rx_char[11] == 0x65) &&
378           (rx_char[12] == 0x73) && (rx_char[13] == 0x73) && (rx_char[14] == 0x69) &&
379           (rx_char[15] == 0x6E) && (rx_char[16] == 0x67)) {
380
381     rx_uart = SET_PROPROCESSING;
382     uart_rx_flag = 1;
383 //*****
384 // Detection the command "burst"
385 //*****
386 } else if ((rx_char[0] == 0x62) && (rx_char[1] == 0x75) && (rx_char[2] == 0x72) &&
387           (rx_char[3] == 0x73) && (rx_char[4] == 0x74)) {
388
389     rx_uart = BURST;
390     uart_rx_flag = 1;
391 //*****
392 // Detection the command "cali_burst"
393 //*****
394 } else if ((rx_char[0] == 0x63) && (rx_char[1] == 0x61) && (rx_char[2] == 0x6c) &&
395           (rx_char[3] == 0x69) && (rx_char[4] == 0x5F) && (rx_char[5] == 0x62) &&
396           (rx_char[6] == 0x75) && (rx_char[7] == 0x72) && (rx_char[8] == 0x73) &&
397           (rx_char[9] == 0x74)) {
398
399     rx_uart = CALI_BURST;
400     uart_rx_flag = 1;
401 //*****
402 // Detection the command "cali_clk"
403 //*****
404 } else if ((rx_char[0] == 0x63) && (rx_char[1] == 0x61) && (rx_char[2] == 0x6c) &&
405           (rx_char[3] == 0x69) && (rx_char[4] == 0x5F) && (rx_char[5] == 0x63) &&
406           (rx_char[6] == 0x6c) && (rx_char[7] == 0x6B)) {
407
408     rx_uart = CALI_CLK;
409     uart_rx_flag = 1;
410 //*****
411 // Detection the command "get_burst"
412 //*****
413 } else if ((rx_char[0] == 0x67) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
414           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x62) && (rx_char[5] == 0x75) &&
415           (rx_char[6] == 0x72) && (rx_char[7] == 0x73) && (rx_char[8] == 0x74)) {
416
417     rx_uart = GET_BURST;
418     uart_rx_flag = 1;
419 //*****
420 // Detection the command "get_config"
421 //*****
422
423
424
425

```

```

426 } else if ((rx_char[0] == 0x67) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
427           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x63) && (rx_char[5] == 0x6F) &&
428           (rx_char[6] == 0x6E) && (rx_char[7] == 0x66) && (rx_char[8] == 0x69) &&
429           (rx_char[9] == 0x67)) {
430
431     if((rx_char[11] == 0x30) && (rx_char[12] == 0x30)) {
432         rx_uart = GET_CONFIG_BS;
433     } else {
434         rx_uart = GET_CONFIG_ZS;
435     }
436
437     uart_rx_flag = 1;
438
439     //*****
440     // Detection the command "set_brata"
441     //*****
442 } else if ((rx_char[0] == 0x73) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
443           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x62) && (rx_char[5] == 0x72) &&
444           (rx_char[6] == 0x61) && (rx_char[7] == 0x74) && (rx_char[8] == 0x65)) {
445
446     rx_uart = SET_BRATE;
447     uart_rx_flag = 1;
448
449     //*****
450     // Detection the command "matlabmode"
451     //*****
452 } else if ((rx_char[0] == 0x6D) && (rx_char[1] == 0x61) && (rx_char[2] == 0x74) &&
453           (rx_char[3] == 0x6C) && (rx_char[4] == 0x61) && (rx_char[5] == 0x62) &&
454           (rx_char[6] == 0x6D) && (rx_char[7] == 0x6F) && (rx_char[8] == 0x64) &&
455           (rx_char[9] == 0x65)) {
456
457     rx_uart = MATLABMODE;
458     uart_rx_flag = 1;
459
460     //*****
461     // Detection the command "LTC2376MODE"
462     //*****
463 } else if ((rx_char[0] == 0x6C) && (rx_char[1] == 0x74) && (rx_char[2] == 0x63) &&
464           (rx_char[3] == 0x32) && (rx_char[4] == 0x33) && (rx_char[5] == 0x37) &&
465           (rx_char[6] == 0x36) && (rx_char[7] == 0x6D) && (rx_char[8] == 0x6F) &&
466           (rx_char[9] == 0x64) && (rx_char[10] == 0x65)) {
467
468     rx_uart = LTC2376MODE;
469     uart_rx_flag = 1;
470
471     //*****
472     // Detection the command "AD7691MODE"
473     //*****
474 } else if ((rx_char[0] == 0x61) && (rx_char[1] == 0x64) && (rx_char[2] == 0x37) &&
475           (rx_char[3] == 0x36) && (rx_char[4] == 0x39) && (rx_char[5] == 0x31) &&
476           (rx_char[6] == 0x6D) && (rx_char[7] == 0x6F) && (rx_char[8] == 0x64) &&
477           (rx_char[9] == 0x65)) {
478
479     rx_uart = AD7691MODE;
480     uart_rx_flag = 1;
481
482     //*****
483     // Detection the command "SET_AD5270_BS"
484     //*****
485 } else if ((rx_char[0] == 0x73) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
486           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x61) && (rx_char[5] == 0x64) &&
487           (rx_char[6] == 0x35) && (rx_char[7] == 0x32) && (rx_char[8] == 0x37) &&
488           (rx_char[9] == 0x30) && (rx_char[10] == 0x5F) && (rx_char[11] == 0x62) &&
489           (rx_char[12] == 0x73)) {
490
491     rx_uart = SET_AD5270_BS;
492     uart_rx_flag = 1;
493
494     //*****
495     // Detection the command "SET_AD5270_ZS"
496     //*****
497 } else if ((rx_char[0] == 0x73) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
498           (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x61) && (rx_char[5] == 0x64) &&
499           (rx_char[6] == 0x35) && (rx_char[7] == 0x32) && (rx_char[8] == 0x37) &&
500           (rx_char[9] == 0x30) && (rx_char[10] == 0x5F) && (rx_char[11] == 0x7A) &&
501           (rx_char[12] == 0x73)) {
502
503     rx_uart = SET_AD5270_ZS;
504     uart_rx_flag = 1;
505
506     //*****
507     // Detection the command "why"
508     //*****
509 } else if ((rx_char[0] == 0x77) && (rx_char[1] == 0x68) && (rx_char[2] == 0x79)) {
510     // why
511     rx_uart = WHY;

```

```

511     uart_rx_flag = 1;
512
513 } else {
514     UARTprintf("\n*****\n");
515     UARTprintf("Unknown command!\nYour input was: ");
516     for(index2 = 0; index2 <= index - 1; index2++)
517         UARTprintf("%c", rx_char[index2]);
518
519     UARTprintf("\n*****\n");
520 }
521 }
522
523 //*****
524 // The interrupt handler for the delay and the timeout function.
525 //*****
526 void Timer0IntHandler(void) {
527
528     // Clear the timer interrupt.
529     ROM_TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
530     ROM_TimerDisable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
531
532     if(TIMER_MODE_IS_TIMEOUT) { // Check if it is the delay timer or the timeout timer
533         timeout_stop(); // Stop the timeout mode
534         TIMEOUT_SET;
535     } else if(TIMER_MODE_IS_DELAY) {
536         timeout_stop(); // Stop the delay mode
537         irq_delay_flag = 1;
538     }
539 }
540
541 //*****
542 // The interrupt handler for for the burst and for the LTC2376 mode
543 //*****
544 void Timer1IntHandler(void) {
545     uint32_t pui32ADC0Value[1];
546
547     //*** Variables for the AD7176 test mode ***
548     uint8_t length = 3;
549     uint8_t data[3];
550     uint16_t index = 0;
551     //*****
552
553     // Clear the timer interrupt.
554     ROM_TimerIntClear(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
555
556     if(TIMER1_MODE_IS_BURST) { // Check if burst flag is set
557         if(CC1101_GDO0_IS_HIGH) {
558             CC1101_GDO0_SET_LOW;
559
560             ROM_TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, burst_trigger_time); // Config the clocktime -> g_ui32SysClock / config
561
562         } else {
563             GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00); // Testpin
564             CC1101_GDO0_SET_HIGH; // send the burst trigger
565
566             ROM_TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, burst_config - burst_trigger_time);
567
568             // SysCtlDelay(3302); // 82,55us
569             // SysCtlDelay(3140); // 78,5us
570             // SysCtlDelay(3180); // 79,5us
571             SysCtlDelay(3165); // 79,125us
572             // SysCtlDelay(3100); // 77,5us
573             // SysCtlDelay(3060); // 76,5us
574             // SysCtlDelay(3020); // 75,5us
575             // SysCtlDelay(2940); // 73,5us
576             // SysCtlDelay(2900); // 72,5us
577             // SysCtlDelay(2780); // 69,5us
578
579             GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF); // Testpin
580
581             //*****
582             // !!! ADC Wandlung ink. abspeicherung dauert 3,2us !!!!!!!
583             // ADC hat eine Referenzspannung von 3.3V
584             // Start the current messurment
585             ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3); // Trigger the ADC conversion.
586             while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false)); // Wait for conversion to be completed
587             ADCIntClear(ADC0_BASE, 3); // Clear the ADC interrupt flag.
588             ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 3, pui32ADC0Value); // Read ADC Value.
589             GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF); // Testpin
590             burst_current[asynch_counter] = pui32ADC0Value[0];
591             //*****
592
593             asynch_counter++;
594         }
595     } else if(TIMER1_MODE_IS_LTC2376) { // Check if burst flag is set

```

```
596     LTC2376_CNV_SET_HIGH;           // start a new conversion
597     LTC2376_IRQ_ENABLE;           // Enable the BUSY interrupt
598
599 }else if(TIMER1_MODE_IS_AD7691) { // Check if burst flag is set
600     AD7691_CNV_SET_HIGH;           // start a new conversion
601     delay_us(5);
602     AD7691_CNV_SET_LOW;
603     AD7691_IRQ_ENABLE;           // Enable the BUSY interrupt
604
605 // *****
606 // // !!! ADC Wandlung ink. abspeicherung dauert 3,2us !!!!!!!
607 // // Start the current messurment
608 // ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3); // Trigger the ADC conversion.
609 // while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false)); // Wait for conversion to be completed
610 // ADCIntClear(ADC0_BASE, 3); // Clear the ADC interrupt flag.
611 // ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 3, pui32ADC0Value); // Read ADC Value.
612 // burst_current[AD7691_asynch_counter] = pui32ADC0Value[0];
613 // *****
614
615 }else if(TIMER1_MODE_IS_AD7176) { // Check if burst flag is set
616     AD7176_CS_ENABLE;
617
618     // Config the ADC for single conversion mode -> 0x8010
619     length = 3;
620     data[0] = ADCMODE;
621     data[1] = 0x80;
622     data[2] = 0x10;
623
624     for(index = 0; index < length; index++) {
625         SSIDataPut(SSI3_BASE, data[index]);
626
627         // Wait until SSI3 is done transferring all the data in the transmit FIFO.
628         while(SSI3Busy(SSI3_BASE));
629     }
630
631     AD7176_IRQ_ENABLE;
632 }
633 }
634
635 void Timer2IntHandler(void) {
636
637 }
```

```

1  /*****
2  **   File name       : LTC2376.c
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 22/12/2014
5  **   Last Update    : 27/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : LTC2376 function
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/main.h"
28 #include "header/uart.h"
29 #include "header/spi.h"
30 #include "header/timer.h"
31 #include "header/interrupts.h"
32 #include "header/CC1101.h"
33 #include "header/gpio.h"
34 #include "header/convert.h"
35 #include "header/uart_check.h"
36 #include "header/adc.h"
37 #include "header/LTC2376.h"
38
39 extern uint32_t matlab_mode;
40
41 /*****
42 // LTC2376-20 Test mode
43 // Data declaration for thesting LTC2376
44 // This can be deleted after testing the ADC
45 *****/
46 extern volatile uint8_t LTC2376_index;
47 extern volatile uint8_t LTC2376_count;
48 extern volatile uint32_t LTC2376_data[3]; // 24-bit data storage
49 extern volatile uint32_t LTC2376_asynch_counter;
50 extern volatile uint32_t LTC2376_values;
51 extern volatile uint32_t LTC2376_frequency_time;
52 extern volatile uint32_t LTC2376_value;
53 extern volatile uint32_t LTC2376_value_storage[40000];
54
55 /*****
56 // This function is config the LTC2376 ADC
57 *****/
58 void init_ltc2376(void) {
59
60     // BUSY Input Pin
61     LTC2376_BUSY_SET_INPUT;
62
63     // CNV Output Pin
64     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOM);
65     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_6);
66     LTC2376_CNV_SET_LOW;
67
68     // CS LTC2376 Output Pin
69     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);
70     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1);
71     LTC2376_CS_DISABLE;
72
73     // Set BUSY as interrupt
74     LTC2376_IRQ_FALLING_EDGE;
75     LTC2376_IRQ_DISABLE;
76
77     LTC2376_CS_DISABLE;
78
79 }
80
81 /*****
82 // This function starts the sampling mode
83 *****/
84 void ltc2376_start(uint8_t ltc2376_frequency, uint8_t burst_values) {
85     uint32_t index = 0;

```

```
86
87     uint32_t value_high = 0;
88     uint32_t value_low = 0;
89
90     switch(burst_values) {
91         case BURST_VALUES_50:
92             LTC2376_values = 50; break;
93
94         case BURST_VALUES_100:
95             LTC2376_values = 100; break;
96
97         case BURST_VALUES_150:
98             LTC2376_values = 150; break;
99
100        case BURST_VALUES_200:
101            LTC2376_values = 200; break;
102
103        case BURST_VALUES_250:
104            LTC2376_values = 250; break;
105
106        case BURST_VALUES_300:
107            LTC2376_values = 300; break;
108
109        case BURST_VALUES_350:
110            LTC2376_values = 350; break;
111
112        case BURST_VALUES_400:
113            LTC2376_values = 400; break;
114
115        case BURST_VALUES_450:
116            LTC2376_values = 450; break;
117
118        case BURST_VALUES_500:
119            LTC2376_values = 500; break;
120
121        case BURST_VALUES_550:
122            LTC2376_values = 550; break;
123
124        case BURST_VALUES_600:
125            LTC2376_values = 600; break;
126
127        case BURST_VALUES_650:
128            LTC2376_values = 650; break;
129
130        case BURST_VALUES_700:
131            LTC2376_values = 700; break;
132
133        case BURST_VALUES_750:
134            LTC2376_values = 750; break;
135
136        case BURST_VALUES_800:
137            LTC2376_values = 800; break;
138
139        case BURST_VALUES_850:
140            LTC2376_values = 850; break;
141
142        case BURST_VALUES_900:
143            LTC2376_values = 900; break;
144
145        case BURST_VALUES_1000:
146            LTC2376_values = 1000; break;
147
148        case BURST_VALUES_1500:
149            LTC2376_values = 1500; break;
150
151        case BURST_VALUES_1900:
152            LTC2376_values = 30000; break;
153    }
154
155    // To calculate the frequency_time
156    // (1/(frequency [Hz]*10^-6))
157    switch(ltc2376_frequency) {
158        case BURST_FREQ_50HZ:
159            LTC2376_frequency_time = 20000; break;
160
161        case BURST_FREQ_100HZ:
162            LTC2376_frequency_time = 10000; break;
163
164        case BURST_FREQ_150HZ:
165            LTC2376_frequency_time = 6666; break;
166
167        case BURST_FREQ_200HZ:
168            LTC2376_frequency_time = 5000; break;
169
170        case BURST_FREQ_250HZ:
```

```

171         LTC2376_frequency_time = 4000; break;
172
173     case BURST_FREQ_300HZ:
174         LTC2376_frequency_time = 3333; break;
175
176     case BURST_FREQ_350HZ:
177         LTC2376_frequency_time = 2857; break;
178
179     case BURST_FREQ_400HZ:
180         LTC2376_frequency_time = 2500; break;
181
182     case BURST_FREQ_450HZ:
183         LTC2376_frequency_time = 2222; break;
184
185     case BURST_FREQ_500HZ:
186         LTC2376_frequency_time = 2000; break;
187
188     case BURST_FREQ_550HZ:
189         LTC2376_frequency_time = 1818; break;
190
191     case BURST_FREQ_600HZ:
192         LTC2376_frequency_time = 1666; break;
193
194     case BURST_FREQ_650HZ:
195         LTC2376_frequency_time = 1538; break;
196
197     case BURST_FREQ_700HZ:
198         LTC2376_frequency_time = 1428; break;
199
200     case BURST_FREQ_750HZ:
201         LTC2376_frequency_time = 1333; break;
202
203     case BURST_FREQ_800HZ:
204         LTC2376_frequency_time = 1250; break;
205
206     case BURST_FREQ_850HZ:
207         LTC2376_frequency_time = 1176; break;
208
209     case BURST_FREQ_900HZ:
210         LTC2376_frequency_time = 1111; break;
211
212     case BURST_FREQ_950HZ:
213         LTC2376_frequency_time = 1052; break;
214
215     case BURST_FREQ_1000HZ:
216         LTC2376_frequency_time = 1000; break;
217
218     case BURST_FREQ_2000HZ:
219         LTC2376_frequency_time = 500; break;
220
221     case BURST_FREQ_4000HZ:
222         LTC2376_frequency_time = 250; break;
223
224     case BURST_FREQ_6000HZ:
225         LTC2376_frequency_time = 167; break;
226
227     case BURST_FREQ_8000HZ:
228         LTC2376_frequency_time = 100; // 125; break;
229
230     case BURST_FREQ_10000HZ:
231         LTC2376_frequency_time = 100; break;
232
233 }
234
235 // Start the LTC2376 messurment
236 LTC2376_IRQ_DISABLE;
237 LTC2376_CLEAR_IRQ;
238
239 LTC2376_BUSY_SET_INPUT;
240 LTC2376_IRQ_FALLING_EDGE;
241 LTC2376_IRQ_DISABLE;
242
243 LTC2376_asynch_counter = 0;
244
245 TIMER1config_LTC2376(LTC2376_frequency_time);
246
247 while(LTC2376_asynch_counter != LTC2376_values);
248 TIMER1_STOP;
249
250 value_low = LTC2376_value_storage[0];
251 value_high = LTC2376_value_storage[0];
252
253 for(index = 0 ; index < LTC2376_asynch_counter ; index++) {
254     if(!matlab_mode) { // If Matlab mode is off
255         UARTprintf("%i\n", LTC2376_value_storage[index]);

```

```
256     }else { // If Matlab mode is on
257         if(index == LTC2376_asynch_counter-1) {
258             UARTprintf("%i", LTC2376_value_storage[index]);
259         }else {
260             UARTprintf("%i ", LTC2376_value_storage[index]);
261         }
262     }
263
264     if(LTC2376_value_storage[index] <= value_low)
265         value_low = LTC2376_value_storage[index];
266
267     if(LTC2376_value_storage[index] >= value_high)
268         value_high = LTC2376_value_storage[index];
269 }
270 }
```



```

1  /*****
2  **   File name       : main.c
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 16/05/2014
5  **   Last Update    : 17/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : Main routine
8  **   State          : Final state
9  *****/
10
11 #include <stdint.h>
12 #include <stdbool.h>
13 #include <math.h>
14 #include "inc/hw_ints.h"
15 #include "inc/hw_memmap.h"
16 #include "inc/hw_types.h"
17 #include "driverlib/debug.h"
18 #include "driverlib/fpu.h"
19 #include "driverlib/ssi.h"
20 #include "driverlib/gpio.h"
21 #include "driverlib/interrupt.h"
22 #include "driverlib/pin_map.h"
23 #include "driverlib/rom.h"
24 #include "driverlib/rom_map.h"
25 #include "driverlib/sysctl.h"
26 #include "driverlib/timer.h"
27 #include "driverlib/uart.h"
28 #include "utils/uartstdio.h"
29 #include "header/main.h"
30 #include "header/uart.h"
31 #include "header/spi.h"
32 #include "header/timer.h"
33 #include "header/interrupts.h"
34 #include "header/CC1101.h"
35 #include "header/gpio.h"
36 #include "header/convert.h"
37 #include "header/uart_check.h"
38 #include "header/adc.h"
39 #include "header/LTC2376.h"
40 #include "header/AD7691.h"
41 #include "header/AD7176.h"
42 #include "header/AD5270.h"
43
44 //*****
45 // System settings and clock rate
46 //*****
47 uint32_t g_sw_version           = 150717;
48 uint32_t g_ui32SysClock;
49 uint32_t g_ui32FFlags;
50 uint32_t spiBitRate             = 100000;
51 uint32_t spiBit                = 8;
52 uint32_t spiConfig             = SSI_FRF_MOTO_MODE_0;
53 uint32_t rx_timeout            = 2000;
54 uint32_t tx_timeout            = 2000;
55 uint32_t ui32Baud              = 56000;
56 uint32_t ui32PortNum           = 0;
57 uint32_t ui32SrcClock          = 0;
58 uint32_t matlab_mode           = 1;
59
60 //*****
61 // Communication states
62 //*****
63 uint8_t brate                   = 100;
64 uint8_t packet[10]             = {0x00};
65 uint8_t adress_this_station    = 0xFF;
66
67 //*****
68 // Variables for the CC1101 communication
69 //*****
70 volatile uint8_t rx_data_length = 0; // Number of expect packetes in the RX Mode
71 volatile uint8_t tx_data_length = 0; // Number of packetes to send
72 volatile uint8_t frame_counter  = 0; // Counter for the frames
73 volatile uint8_t rx_command     = COMMAND_WAIT; // Received command
74 volatile uint8_t rx_data[64]   = {0x00}; // RX Data buffer
75 volatile uint8_t command_recived_flag = 0; // Flag for a command received
76
77 //*****
78 // Communication UART
79 //*****
80 volatile uint8_t rx_uart        = 0; // RX command
81 volatile uint8_t uart_rx_flag   = 0; // Flag for the UART
82 volatile unsigned char rx_char[31]; // UART data buffer
83
84 //*****
85 // Interrupt and communication flags

```

```

86 //*****
87 volatile uint8_t irq_mode = TX_MODE; // Flag for the GDO2 mode
88 volatile uint8_t irq_send_done_flag = 0; // Flag for send done
89 volatile uint8_t irq_cal_i_flag = 0; // Flag for burat calibration
90
91 volatile uint8_t irq_timer0_mode = DELAY_MODE; // Flag for the timer mode
92 volatile uint8_t irq_timer1_mode = BURST_MODE; // Flag for the timer1 mode
93 volatile uint8_t irq_delay_flag = 0; // Flag for the delay timer
94 volatile uint8_t irq_timeout = 0; // Flag for the time out timer
95
96 //*****
97 // Burst Mode
98 //*****
99 volatile uint8_t burst_freq = BURST_FREQ_1000HZ; // Burst Frequenz
100 uint8_t burst_values = 0; // Anzahl der Burst Werte
101 uint16_t seq_number = 0; // Zählt die Seq.nummer
102 volatile uint16_t asynch_counter = 0; // Counts the TX trigger
103 volatile uint32_t burst_config = 0; // Frequency time for the burst timer
104
105 volatile uint32_t burst_data[2000]; // Save the burst data
106 volatile uint32_t burst_current[2000]; // Save the current date
107 volatile uint32_t burst_trigger_time = 500; // Time (in us) for the burst trigger
108
109
110 //*****
111 // Clock calibration mode
112 //*****
113 volatile uint32_t clk_cal_i_counter = 0; // Counter for the clock calibration
114 volatile uint32_t adc_value[40];
115 volatile uint32_t clk_numb_counts = 40; // number of measurments for the calibration
116 volatile uint32_t clk_tolerance = 200; // tolerance of the clk calibration
117
118 //*****
119 // LTC2376-20 Test mode
120 // Data declaration for thesting LTC2376
121 // This can be deleted after testing the ADC
122 //*****
123 volatile uint8_t LTC2376_index = 0;
124 volatile uint8_t LTC2376_count = 3;
125 volatile uint32_t LTC2376_data[3]; // 20-bit data storage
126 volatile uint32_t LTC2376_asynch_counter = 0;
127 volatile uint32_t LTC2376_values = 0;
128 volatile uint32_t LTC2376_frequency_time = 0;
129 volatile uint32_t LTC2376_value;
130 volatile uint32_t LTC2376_value_storage[40000];
131
132 //*****
133 // AD7691 Test mode
134 // Data declaration for thesting AD7691
135 // This can be deleted after testing the ADC
136 //*****
137 volatile uint8_t AD7691_index = 0;
138 volatile uint8_t AD7691_count = 2;
139 volatile uint32_t AD7691_data[2]; // 20-bit data storage
140 volatile uint32_t AD7691_asynch_counter = 0;
141 volatile uint32_t AD7691_values = 0;
142 volatile uint32_t AD7691_frequency_time = 0;
143 volatile uint32_t AD7691_value;
144 volatile uint32_t AD7691_value_storage[2000];
145
146 //*****
147 // AD7176 Test mode
148 // Data declaration for thesting AD7176
149 // This can be deleted after testing the ADC
150 //*****
151 volatile uint8_t AD7176_index = 0;
152 volatile uint8_t AD7176_count = 3; // 3*8Bit readout
153 volatile uint32_t AD7176_data[3]; // 3*8bit data storage
154 volatile uint32_t AD7176_asynch_counter = 0;
155 volatile uint32_t AD7176_values = 0;
156 volatile uint32_t AD7176_frequency_time = 0;
157 volatile uint32_t AD7176_value;
158 volatile uint32_t AD7176_value_storage[2000];
159
160 //*****
161 // Goertzel calculatoin
162 //*****
163 float Fs_goertzel = 0.0; // Burstfrequency
164 float f_goertzel = 0.0; // Signal frequency
165 float m = 0.0;
166 float bn_0 = 0;
167 float bn_1 = 0;
168 float bn_2 = 0;
169 float N_float;
170 float omega;

```

```

171 float sine;
172 float cosine;
173 float coeff;
174
175 float Np;
176 float f_voltage = 0.0;
177
178 typedef union {
179     float float_data;
180     uint8_t hex_data[4];
181 } FB;
182
183 FB real_char;
184 FB imag_char;
185
186 //*****
187 // The error routine that is called if the driver library encounters an error.
188 //*****
189 #ifdef DEBUG
190 void
191 __error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line)
192 {
193 }
194 #endif
195
196
197 int main(void) {
198     ROM_IntDisable(INT_WATCHDOG); // Disable the watchdog-timer
199
200     // Set the clocking to run directly from the crystal at 120MHz.
201     g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
202     SYSCTL_OSC_MAIN |
203     SYSCTL_USE_PLL |
204     SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
205
206     ui32SrcClock = g_ui32SysClock;
207
208     // Initialize the UART and write status.
209     UARTInit(ui32PortNum, ui32Baud, ui32SrcClock);
210
211     // Initialize the SPI
212     SPIInit(spiBitRate, spiBit, spiConfig);
213
214     // Initialize the timer.
215     TIMER0init(); // For the timer
216     TIMER1init(); // For the burt measurement
217     TIMER2init();
218
219     GPIOinit();
220
221     init_ltc2376();
222     //init_ad7691();
223
224     init_adc();
225
226     cc1101_power_up_reset();
227
228     LED_test();
229
230     // Interrupt Priority
231     IntPrioritySet(INT_SYSCTL, 0x00); // SysTick 1st Priority
232     IntPrioritySet(INT_ADCOSS0, 0x10);
233     IntPrioritySet(INT_TIMER0A, 0x20);
234     IntPrioritySet(INT_TIMER1A, 0x40);
235     IntPrioritySet(INT_TIMER2A, 0x60);
236     IntPrioritySet(INT_GPIOK, 0x80);
237     IntPrioritySet(INT_UART0, 0xA0);
238
239     // Enable processor interrupts.
240     ROM_IntMasterEnable();
241
242     while(1) {
243
244         while(!uart_rx_flag);
245
246         switch(rx_uart) {
247             //*****
248             // "help" Open the help menue
249             //*****
250             case HELP: {
251                 UARTprintf("\n
252                 *****\n
253                 n");
254
255                 UARTprintf("These are the possible commands:\n");

```

```

254     UARTprintf("-----\n");
255     UARTprintf("\n");
256     UARTprintf("get_voltage(NUMBER OF SENSOR)      -> Receive the voltage of a sensor\n");
257     UARTprintf("for get the voltage of sensor 0x02, please type -> get_voltage(02)\n");
258     UARTprintf("\n");
259     UARTprintf("\n");
260     UARTprintf("burst(BURST FREQUENCY, NUMBER OF VALUES) -> Starts the burst mode\n");
261     UARTprintf("Possible frequencys and number of values are the following:\n");
262     UARTprintf("burst frequency  number of values\n");
263     UARTprintf("-----\n");
264     UARTprintf("4.000 Hz          1.900\n");
265     UARTprintf("2.000 Hz          1.500\n");
266     UARTprintf("1.000 Hz          1.000\n");
267     UARTprintf(" 950 Hz           900\n");
268     UARTprintf(" 900 Hz           850\n");
269     UARTprintf(" 850 Hz           800\n");
270     UARTprintf(" 800 Hz           750\n");
271     UARTprintf(" 750 Hz           700\n");
272     UARTprintf(" 700 Hz           650\n");
273     UARTprintf(" 650 Hz           600\n");
274     UARTprintf(" 600 Hz           550\n");
275     UARTprintf(" 550 Hz           500\n");
276     UARTprintf(" 500 Hz           450\n");
277     UARTprintf(" 450 Hz           400\n");
278     UARTprintf(" 400 Hz           350\n");
279     UARTprintf(" 350 Hz           300\n");
280     UARTprintf(" 300 Hz           250\n");
281     UARTprintf(" 250 Hz           200\n");
282     UARTprintf(" 200 Hz           150\n");
283     UARTprintf(" 150 Hz           100\n");
284     UARTprintf(" 100 Hz            50\n");
285     UARTprintf(" 50 Hz\n");
286     UARTprintf("\n");
287     UARTprintf("\n");
288     UARTprintf("send_hex(HEX1 HEX2 HEX3 HEX4)      -> Sends four hex values to a sensor and expet a four
        hex answer form the sensor\n");
289     UARTprintf("get_config                          -> Returns the actually config of the basestation\n");
        ;
290
291     UARTprintf("\n
        *****\n");
292
293     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
294 } break;
295 //*****
296 case WHY: {
297     UARTprintf("Why not?!\n");
298     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
299 } break;
300
301 //*****
302 // get_voltage(Sensor Address);
303 // returns the voltage of the cell
304 //*****
305 case GET_VOLTAGE: {
306     uint16_t volt_msb = 0;
307     uint16_t volt_lsb = 0;
308
309     UARTprintf("\n");
310     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
311
312     if(check_input()) { // Check if the type command was correct
313
314         // rx_char[12] and rx_char[13] are the adress of the sensor
315         packet[0] = char_to_hex(rx_char[12],rx_char[13]);
316         packet[1] = COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE;
317         packet[2] = 0x00;
318         packet[3] = 0x00;
319
320         tx_data_length = 0; // Normal Data length
321         tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
322
323         delay_ms(1000); // wait till the next command is send
324
325         // rx_char[12] and rx_char[13] are the address of the sensor
326         packet[0] = char_to_hex(rx_char[12],rx_char[13]);
327         packet[1] = COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE;
328         packet[2] = 0x00;
329         packet[3] = 0x00;
330
331         tx_data_length = 0; // Normal Data length
332         tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
333
334         rx_data_length = 2; // Normal Data length

```

```

335         rx_packet(HEADER_LENGTH + rx_data_length);           // Config CC1101 for data receive
336
337         // Decode the voltage information form the sensor
338         volt_msb = (((uint16_t)(rx_data[HEADER_LENGTH + 0] & 0x0F)) << 8) & 0x0F00;
339         volt_lsb = (((uint16_t)(rx_data[HEADER_LENGTH + 1] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
340
341         // Check if the timeout flag is set
342         if (TIMEOUT_IS_SET) {
343             if (!matlab_mode) {
344                 UARTprintf("No answer from sensor 0x%x!\n", packet[0]);
345             }
346         } else {
347             if (!matlab_mode) {
348                 UARTprintf("%i\n", (volt_msb | volt_lsb));
349             } else {
350                 UARTprintf("%i\n", (volt_msb | volt_lsb));
351             }
352         }
353     }
354 }
355 } break;
356
357 //*****
358 // get_goertzel();
359 // returns the real and imaginary part of the messurement data
360 //*****
361 case GET_GORTZEL: {
362
363     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
364
365     uint16_t num_samples = asynch_counter;
366     uint16_t N = 0; // Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
367     uint16_t Np = 0; // Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
368
369     uint16_t print_freq = (char_to_int2(rx_char[25], rx_char[26])*100 + char_to_int2(rx_char[27], rx_char[28]))
370     ;
371     uint16_t print_freq2 = (char_to_int(rx_char[30]));
372
373     m = (float) char_to_int2(rx_char[16], rx_char[17]);
374     Fs_goertzel = (float) (char_to_int3(rx_char[19], rx_char[20], rx_char[21])*100 + char_to_int2(rx_char[22],
375     rx_char[23]));
376     f_goertzel = (float) (char_to_int2(rx_char[25], rx_char[26])*100 + char_to_int2(rx_char[27], rx_char[28]) +
377     0.1* char_to_int(rx_char[30]));
378
379     Np = Fs_goertzel/f_goertzel;
380     N = m * Np;
381
382     UARTprintf("\n");
383
384     if(N > num_samples) {
385         UARTprintf("***** ERROR
386         *****\n");
387         UARTprintf("It is not possible to calculate these numbers of perodes , please check your input values
388         !!\n");
389         UARTprintf("To calculate these number of perodes , you need %i samples. But you only have %i samples
390         .\n", N, num_samples);
391         UARTprintf("***** ERROR
392         *****\n");
393     } else {
394         UARTprintf("Start to calculate the DFT values with %i samples\n", N);
395         UARTprintf("The possible samples are %i\n", num_samples);
396         UARTprintf("Number of perodes: %i\n", (int)m);
397         UARTprintf("Burst frequency: %i Hz\n", (int)Fs_goertzel);
398         UARTprintf("Signal frequency: %i.%i Hz\n", print_freq , print_freq2);
399
400         // Send the number of perodes
401         packet[0] = char_to_hex(rx_char[13], rx_char[14]);
402         packet[1] = COMMAND_GOERTZEL_NUMB_PERI;
403         packet[2] = char_to_int2(rx_char[16], rx_char[17]);
404         packet[3] = 0x00;
405
406         tx_data_length = 0; // Normal Data length
407         tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length , packet); // Config CC1101 for data tranceive
408
409         delay_ms(100);
410
411         // Send the Goertzel frequency
412         packet[0] = char_to_hex(rx_char[13], rx_char[14]);
413         packet[1] = COMMAND_GOERTZEL_FREQ;
414         packet[2] = char_to_int3(rx_char[19], rx_char[20], rx_char[21]);
415         packet[3] = char_to_int2(rx_char[22], rx_char[23]);
416
417         tx_data_length = 0; // Normal Data length
418         tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length , packet); // Config CC1101 for data tranceive
419
420     }

```

```

413     delay_ms(100);
414
415     // Send the stimuli frequency
416     packet[0] = char_to_hex(rx_char[13],rx_char[14]);
417     packet[1] = COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ;
418     packet[2] = char_to_int2(rx_char[25],rx_char[26]);
419     packet[3] = char_to_int2(rx_char[27],rx_char[28]);
420
421     tx_data_length = 0; // Normal Data length
422     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
423
424     delay_ms(100);
425
426     // Send the stimuli frequency
427     packet[0] = char_to_hex(rx_char[13],rx_char[14]);
428     packet[1] = COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ2;
429     packet[2] = char_to_int(rx_char[30]);
430     packet[3] = 0x00;
431
432     tx_data_length = 0; // Normal Data length
433     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
434
435     delay_ms(100);
436
437     packet[0] = char_to_hex(rx_char[13],rx_char[14]);
438     packet[1] = COMMAND_GOERTZEL;
439     packet[2] = 0x00;
440     packet[3] = 0x00;
441
442     tx_data_length = 0;
443     // Normal Data length
444     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
445
446     rx_timeout = 10000; // expand the delay time
447     rx_data_length = 8; // Normal Data length
448     rx_packet(HEADER_LENGTH + rx_data_length); // Config CC1101 for data receive
449     rx_timeout = 2000; // reset the delay time
450
451     // Decode the volage information form the sensor
452     real_char.hex_data[3] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 0] & 0xFF);
453     real_char.hex_data[2] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 1] & 0xFF);
454     real_char.hex_data[1] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 2] & 0xFF);
455     real_char.hex_data[0] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 3] & 0xFF);
456
457     imag_char.hex_data[3] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 4] & 0xFF);
458     imag_char.hex_data[2] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 5] & 0xFF);
459     imag_char.hex_data[1] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 6] & 0xFF);
460     imag_char.hex_data[0] = (rx_data[HEADER_LENGTH + 7] & 0xFF);
461
462     rx_data_length = 0; // Normal Data length
463
464     // Check if the timeout flag is set
465     if (TIMEOUT_IS_SET) {
466         UARTprintf("No answer from sensor 0x%x!\n",packet[0]);
467     } else {
468         // Printing the data
469         if (real_char.hex_data[3] < 0x10) {
470             UARTprintf("%i",0);
471         }
472         UARTprintf("%x", real_char.hex_data[3]);
473
474         if (real_char.hex_data[2] < 0x10) {
475             UARTprintf("%i",0);
476         }
477         UARTprintf("%x", real_char.hex_data[2]);
478
479         if (real_char.hex_data[1] < 0x10) {
480             UARTprintf("%i",0);
481         }
482         UARTprintf("%x", real_char.hex_data[1]);
483
484         if (real_char.hex_data[0] < 0x10) {
485             UARTprintf("%i",0);
486         }
487         UARTprintf("%x\n", real_char.hex_data[0]);
488
489         if (imag_char.hex_data[3] < 0x10) {
490             UARTprintf("%i",0);
491         }
492         UARTprintf("%x", imag_char.hex_data[3]);
493
494         if (imag_char.hex_data[2] < 0x10) {
495             UARTprintf("%i",0);
496         }
497         UARTprintf("%x", imag_char.hex_data[2]);

```

```

498
499         if (imag_char.hex_data[1] < 0x10) {
500             UARTprintf("%i", 0);
501         }
502         UARTprintf("%x", imag_char.hex_data[1]);
503
504         if (imag_char.hex_data[0] < 0x10) {
505             UARTprintf("%i", 0);
506         }
507         UARTprintf("%x\n", imag_char.hex_data[0]);
508     }
509
510     // Calculate the Goertzel with the current data
511
512     int index;
513     int k;
514     int N_int;
515
516     real_char.float_data = 0.0;
517     imag_char.float_data = 0.0;
518
519     bn_0 = 0; // Reset the coefficients
520     bn_1 = 0; // Reset the coefficients
521     bn_2 = 0; // Reset the coefficients
522
523     Np = Fs_goertzel/f_goertzel; // Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
524     N_float = m * Np; // Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
525     N_int = (int) N_float;
526
527
528     // Precalculate the coefficients and the sine/cosine
529     k = (int) (0.5 + ((N_float * f_goertzel) / Fs_goertzel));
530     omega = (2.0 * 3.141592654 * k) / N_float;
531     sine = sinf(omega);
532     cosine = cosf(omega);
533     coeff = 2.0 * cosine;
534
535     /*** BEGIN the Goertzel algorithm ***/
536     for (index = 0; index < N_int + 1; index++) {
537
538         if (index == N_int) { // the last sample have to be zero
539             bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + 0;
540         } else {
541             f_voltage = (((0.00080586)*burst_current[index])*(1/0.1));
542             bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + f_voltage;
543         }
544
545         bn_2 = bn_1;
546         bn_1 = bn_0;
547     }
548
549     real_char.float_data = (bn_1 - bn_2 * cosine);
550     imag_char.float_data = (bn_2 * sine);
551
552     /*** END the Goertzel algorithm ***/
553
554     // Printing the data
555     if (real_char.hex_data[3] < 0x10) {
556         UARTprintf("%i", 0);
557     }
558     UARTprintf("%x", real_char.hex_data[3]);
559
560     if (real_char.hex_data[2] < 0x10) {
561         UARTprintf("%i", 0);
562     }
563     UARTprintf("%x", real_char.hex_data[2]);
564
565     if (real_char.hex_data[1] < 0x10) {
566         UARTprintf("%i", 0);
567     }
568     UARTprintf("%x", real_char.hex_data[1]);
569
570     if (real_char.hex_data[0] < 0x10) {
571         UARTprintf("%i", 0);
572     }
573     UARTprintf("%x\n", real_char.hex_data[0]);
574
575     if (imag_char.hex_data[3] < 0x10) {
576         UARTprintf("%i", 0);
577     }
578     UARTprintf("%x", imag_char.hex_data[3]);
579
580     if (imag_char.hex_data[2] < 0x10) {
581         UARTprintf("%i", 0);
582     }

```

```

583     }
584     UARTprintf("%x", imag_char.hex_data[2]);
585
586     if(imag_char.hex_data[1] < 0x10) {
587         UARTprintf("%i", 0);
588     }
589     UARTprintf("%x", imag_char.hex_data[1]);
590
591     if(imag_char.hex_data[0] < 0x10) {
592         UARTprintf("%i", 0);
593     }
594     UARTprintf("%x\n", imag_char.hex_data[0]);
595 }
596
597 } break;
598
599 //*****
600 // get_config(ADDRESS OF THE SENSOR);
601 // returns the actual config of the cellsensor
602 //*****
603 case GET_CONFIG_ZS: {
604     uart_rx_flag = 0;    // Reset the UART flag
605
606     // rx_char[7] and rx_char[8] are the address of the sensor
607     packet[0] = char_to_hex(rx_char[11], rx_char[12]);
608     packet[1] = COMMAND_SW;
609     packet[2] = 0x00;
610     packet[3] = 0x00;
611
612     tx_data_length = 0;           // Normal Data length
613     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
614
615     rx_data_length = 18;         // Normal Data length
616     rx_packet(HEADER_LENGTH + rx_data_length); // Config CC1101 for data receive
617
618     // Check if the timeout flag is set
619     if (TIMEOUT_IS_SET) {
620         UARTprintf("No answer from sensor 0x%x!\n", packet[0]);
621     } else {
622         UARTprintf("**** Software of sensor 0x%x ****\n", packet[0]);
623         UARTprintf("Software version      : %i\n", rx_data[4]);
624         UARTprintf("\n");
625         if(rx_data[5] == 0x00) {
626             UARTprintf("Selected ADC          : CC430 ADC\n");
627         } else if(rx_data[5] == 0x01) {
628             UARTprintf("Selected ADC          : AD7691\n");
629         }
630         UARTprintf("\n");
631         UARTprintf("CC1101 data rate      : %i kbps\n", rx_data[6]);
632         UARTprintf("Burst frame lenght    : %i byte per frame\n", rx_data[7]);
633         UARTprintf("\n");
634
635         UARTprintf("\n**** Balancing configurartion ****\n");
636         UARTprintf("Target balancing value : %i \n", (rx_data[8] << 8) + rx_data[9] );
637         UARTprintf("Upper balancing limit  : %i \n", (rx_data[10] << 8) + rx_data[11]);
638         UARTprintf("Lower balancing limit   : %i \n", (rx_data[12] << 8) + rx_data[13]);
639         UARTprintf("Upper alarm limit      : %i \n", (rx_data[14] << 8) + rx_data[15]);
640         UARTprintf("Lower alarm limit      : %i \n", (rx_data[16] << 8) + rx_data[17] );
641
642         UARTprintf("\n**** Preprocessing information ****\n");
643         UARTprintf("Rheostat for the offset : 0x%x \n", (rx_data[18] << 8) + (rx_data[19] << 0));
644         UARTprintf("Rheostat for the gain   : 0x%x \n", (rx_data[20] << 8) + (rx_data[21] << 0));
645
646     }
647 }
648
649 } break;
650
651 //*****
652 // "send_hex" sends four hex values with the ccl101
653 // Example: send_hex(00 04 00 00) -> sends the hex values "0x00 0x04 0x00 0x00"
654 //*****
655 case SEND_HEX: {
656     UARTprintf("Send HEX\n");
657     uart_rx_flag = 0;    // Reset the UART flag
658
659     if(check_input()) { // Check if the type command was correct
660         packet[0] = char_to_hex(rx_char[9], rx_char[10]);
661         packet[1] = char_to_hex(rx_char[12], rx_char[13]);
662         packet[2] = char_to_hex(rx_char[15], rx_char[16]);
663         packet[3] = char_to_hex(rx_char[18], rx_char[19]);
664
665         tx_data_length = 0; // Normal Data length
666         tx_packet(4, packet); // Config CC1101 for data tranceive
667     }

```



```

668         rx_data_length = 2;                                     // Normal Data length
669         rx_packet(HEADER_LENGTH + rx_data_length);           // Config CC1101 for data receive
670
671         // Check if the timeout flag is set
672         if (TIMEOUT_IS_SET) {
673             if (!matlab_mode) {
674                 UARTprintf("Timeout pending!\n");
675             }
676         } else {
677             uint8_t index;
678             for (index = 0; index < (HEADER_LENGTH + rx_data_length); index++) {
679                 UARTprintf("%x\n", rx_data[index]);
680             }
681             UARTprintf("\n");
682         }
683     }
684 } break;
685
686
687 //*****
688 // get_config(ADDRESS OF THE BASESTATION);
689 // returns the actual config of the basestation
690 //*****
691 case GET_CONFIG_BS: {
692     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
693
694     if(check_input()) { // Check if the type command was correct
695         UARTprintf("**** Software base station ****\n");
696         UARTprintf("Software version      : %i\n", g_sw_version);
697
698         UARTprintf("\n**** System configuraton ****\n");
699         UARTprintf("Clock speed          : %i MHz\n", ui32SrcClock/1000000);
700         UARTprintf("Wait to RX data       : %i ms\n", rx_timeout);
701         UARTprintf("Wait to TX data       : %i ms\n", tx_timeout);
702
703         UARTprintf("\n**** SPI configuraton ****\n");
704         UARTprintf("SPI speed           : %i kHz\n", spiBitRate/1000);
705         UARTprintf("SPI number of bits    : %i Bit\n", spiBit);
706         if(spiConfig == SSI_FRF_MOTO_MODE_0) {
707             UARTprintf("SPI config          : Mode 0\n", spiBit);
708         } else if(spiConfig == SSI_FRF_MOTO_MODE_1) {
709             UARTprintf("SPI config          : Mode 1\n", spiBit);
710         } else if(spiConfig == SSI_FRF_MOTO_MODE_2) {
711             UARTprintf("SPI config          : Mode 2\n", spiBit);
712         } else if(spiConfig == SSI_FRF_MOTO_MODE_3) {
713             UARTprintf("SPI config          : Mode 3\n", spiBit);
714         } else if(spiConfig == SSI_FRF_TI) {
715             UARTprintf("SPI config          : TI format\n", spiBit);
716         } else if(spiConfig == SSI_FRF_NMW) {
717             UARTprintf("SPI config          : National MicroWire frame format\n", spiBit);
718         }
719
720         UARTprintf("\n**** CC1101 configuraton ****\n");
721         UARTprintf("CC1101 data rate     : %i kbps\n", brate);
722         UARTprintf("Adress this station   : 0x%x\n", address_this_station);
723
724         UARTprintf("\n**** UART configuraton ****\n");
725         UARTprintf("UART port number     : %i\n", ui32PortNum);
726         UARTprintf("UART data rate       : %i Baud\n", ui32Baud);
727         UARTprintf("UART clock           : %i MHz\n", ui32SrcClock/1000000);
728         UARTprintf("RX Terminator        : CR\n");
729         UARTprintf("TX Terminator        : CR + LF\n");
730
731         UARTprintf("\n**** Matlab mode ****\n");
732         if (!matlab_mode) {
733             UARTprintf("Matlab mode is      : OFF\n");
734         } else {
735             UARTprintf("Matlab mode is      : ON\n");
736         }
737
738         UARTprintf("\n**** DCO calibration ****\n");
739         UARTprintf("Number of measurements : %i\n", clk_num counts);
740         UARTprintf("Tolerance of the DCO   : %i Ticks\n", clk_tolerance);
741
742     }
743 }
744 } break;
745
746 //*****
747 // "set_brata" mode.
748 //*****
749 case SET_BRATE: {
750     UARTprintf("Set Boud rate!\n");
751     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
752 }

```

```

753     check_input();
754
755     if(rx_char[12] != 0x30)
756         brate = (10*char_to_int(rx_char[10])) + (char_to_int(rx_char[12]));
757     else {
758         brate = (100*char_to_int(rx_char[10])) + (10*char_to_int(rx_char[11])) + (char_to_int(rx_char[12]));
759     }
760
761 } break;
762
763 //*****
764 // "matlabmode" mode.
765 //*****
766 case MATLABMODE: {
767     uart_rx_flag = 0;    // Reset the UART flag
768     //check_input();
769
770     if((rx_char[11] == 0x6F) && (rx_char[12] == 0x6E)) {
771         matlab_mode = 1;
772         UARTprintf("Matlab mode is on\n");
773     } else if((rx_char[11] == 0x6F) && (rx_char[12] == 0x66) && (rx_char[13] == 0x66)) {
774         matlab_mode = 0;
775         UARTprintf("Matlab mode is off\n");
776     }
777
778 } break;
779
780 //*****
781 // set_preprocessing();
782 // set the analog preprocessing
783 //*****
784 case SET_PROPROCESSING: {
785
786     uart_rx_flag = 0;    // Reset the UART flag
787
788     UARTprintf("Set preprocessing on sensor 0x%x\n", char_to_hex(rx_char[18],rx_char[19]));
789
790     // rx_char[12] and rx_char[13] are the address of the sensor
791     packet[0] = char_to_hex(rx_char[18],rx_char[19]);
792     packet[1] = COMMAND_SET_PREPROCESSING;
793     packet[2] = 0x00;
794     packet[3] = 0x00;
795
796     tx_data_length = 0;                // Normal Data length
797     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet);    // Config CC1101 for data tranceive
798
799 } break;
800 //*****
801 // Burstmode. Detect fhe frequency and the number of values and start the burst mode
802 //*****
803 case BURST: {
804     uint8_t frequency_true = 0;
805     uint8_t value = 0;
806     uint8_t value_true = 0;
807     uint8_t position = 0;
808
809     uart_rx_flag = 0;    // Reset the UART flag
810
811     if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) && (
812         rx_char[10] == 0x30) && (rx_char[11] == 0x30)) {
813         burst_freq = BURST_FREQ_100000HZ;
814         position = 12;
815         frequency_true = 1;
816     } else if((rx_char[6] == 0x39) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
817         (rx_char[10] == 0x30)) {
818         burst_freq = BURST_FREQ_95000HZ;
819         position = 11;
820         frequency_true = 1;
821     } else if((rx_char[6] == 0x39) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
822         (rx_char[10] == 0x30)) {
823         burst_freq = BURST_FREQ_90000HZ;
824         position = 11;
825         frequency_true = 1;
826     } else if((rx_char[6] == 0x38) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
827         (rx_char[10] == 0x30)) {
828         burst_freq = BURST_FREQ_85000HZ;
829         position = 11;
830         frequency_true = 1;
831     } else if((rx_char[6] == 0x37) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
832         (rx_char[10] == 0x30)) {

```



```
900         burst_freq = BURST_FREQ_20000HZ;
901         position = 11;
902         frequency_true = 1;
903     } else if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x38) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
904             (rx_char[10] == 0x30)) {
905         burst_freq = BURST_FREQ_18000HZ;
906         position = 11;
907         frequency_true = 1;
908     } else if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x36) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
909             (rx_char[10] == 0x30)) {
910         burst_freq = BURST_FREQ_16000HZ;
911         position = 11;
912         frequency_true = 1;
913     } else if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x34) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
914             (rx_char[10] == 0x30)) {
915         burst_freq = BURST_FREQ_14000HZ;
916         position = 11;
917         frequency_true = 1;
918     } else if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x32) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30) &&
919             (rx_char[10] == 0x30)) {
920         burst_freq = BURST_FREQ_12000HZ;
921         position = 11;
922         frequency_true = 1;
923     } else if((rx_char[6] == 0x38) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30)) {
924         burst_freq = BURST_FREQ_8000HZ;
925         position = 10;
926         frequency_true = 1;
927     } else if((rx_char[6] == 0x36) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30)) {
928         burst_freq = BURST_FREQ_6000HZ;
929         position = 10;
930         frequency_true = 1;
931     } else if((rx_char[6] == 0x34) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30)) {
932         burst_freq = BURST_FREQ_4000HZ;
933         position = 10;
934         frequency_true = 1;
935     } else if((rx_char[6] == 0x32) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30)) {
936         burst_freq = BURST_FREQ_2000HZ;
937         position = 10;
938         frequency_true = 1;
939     } else if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30) && (rx_char[9] == 0x30)) {
940         burst_freq = BURST_FREQ_1000HZ;
941         position = 10;
942         frequency_true = 1;
943     } else if((rx_char[6] == 0x39) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
944         burst_freq = BURST_FREQ_950HZ;
945         position = 9;
946         frequency_true = 1;
947     } else if((rx_char[6] == 0x39) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
948         burst_freq = BURST_FREQ_900HZ;
949         position = 9;
950         frequency_true = 1;
951     } else if((rx_char[6] == 0x38) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
952         burst_freq = BURST_FREQ_850HZ;
953         position = 9;
954         frequency_true = 1;
955     } else if((rx_char[6] == 0x38) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
956         burst_freq = BURST_FREQ_800HZ;
957         position = 9;
958         frequency_true = 1;
959     } else if((rx_char[6] == 0x37) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
960         burst_freq = BURST_FREQ_750HZ;
961         position = 9;
962         frequency_true = 1;
963     } else if((rx_char[6] == 0x37) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
964         burst_freq = BURST_FREQ_700HZ;
965         position = 9;
966         frequency_true = 1;
967     } else if((rx_char[6] == 0x36) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
968         burst_freq = BURST_FREQ_650HZ;
969         position = 9;
970         frequency_true = 1;
971     } else if((rx_char[6] == 0x36) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
972         burst_freq = BURST_FREQ_600HZ;
973         position = 9;
974         frequency_true = 1;
975     } else if((rx_char[6] == 0x35) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
976         burst_freq = BURST_FREQ_550HZ;
977         position = 9;
978         frequency_true = 1;
979     } else if((rx_char[6] == 0x35) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
```

```
980         burst_freq = BURST_FREQ_500HZ;
981         position = 9;
982         frequency_true = 1;
983     } else if((rx_char[6] == 0x34) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
984         burst_freq = BURST_FREQ_450HZ;
985         position = 9;
986         frequency_true = 1;
987     } else if((rx_char[6] == 0x34) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
988         burst_freq = BURST_FREQ_400HZ;
989         position = 9;
990         frequency_true = 1;
991     } else if((rx_char[6] == 0x33) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
992         burst_freq = BURST_FREQ_350HZ;
993         position = 9;
994         frequency_true = 1;
995     } else if((rx_char[6] == 0x33) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
996         burst_freq = BURST_FREQ_300HZ;
997         position = 9;
998         frequency_true = 1;
999     } else if((rx_char[6] == 0x32) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
1000         burst_freq = BURST_FREQ_250HZ;
1001         position = 9;
1002         frequency_true = 1;
1003     } else if((rx_char[6] == 0x32) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
1004         burst_freq = BURST_FREQ_200HZ;
1005         position = 9;
1006         frequency_true = 1;
1007     } else if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x35) && (rx_char[8] == 0x30)) {
1008         burst_freq = BURST_FREQ_150HZ;
1009         position = 9;
1010         frequency_true = 1;
1011     } else if((rx_char[6] == 0x31) && (rx_char[7] == 0x30) && (rx_char[8] == 0x30)) {
1012         burst_freq = BURST_FREQ_100HZ;
1013         position = 9;
1014         frequency_true = 1;
1015     } else if((rx_char[6] == 0x35) && (rx_char[7] == 0x30)) {
1016         burst_freq = BURST_FREQ_50HZ;
1017         position = 8;
1018         frequency_true = 1;
1019     }
1020 }
1021 if((rx_char[position+1] == 0x32) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30) && (
1022     rx_char[position+4] == 0x30)) {
1023     value = BURST_VALUES_2500;
1024     value_true = 1;
1025 } else if((rx_char[position+1] == 0x32) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1026     && (rx_char[position+4] == 0x30)) {
1027     value = BURST_VALUES_2000;
1028     value_true = 1;
1029 } else if((rx_char[position+1] == 0x31) && (rx_char[position+2] == 0x39) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1030     && (rx_char[position+4] == 0x30)) {
1031     value = BURST_VALUES_1900;
1032     value_true = 1;
1033 } else if((rx_char[position+1] == 0x31) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1034     && (rx_char[position+4] == 0x30)) {
1035     value = BURST_VALUES_1500;
1036     value_true = 1;
1037 } else if((rx_char[position+1] == 0x31) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1038     && (rx_char[position+4] == 0x30)) {
1039     value = BURST_VALUES_1000;
1040     value_true = 1;
1041 } else if((rx_char[position+1] == 0x39) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1042     ) {
1043     value = BURST_VALUES_900;
1044     value_true = 1;
1045 } else if((rx_char[position+1] == 0x38) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1046     ) {
1047     value = BURST_VALUES_850;
1048     value_true = 1;
1049 } else if((rx_char[position+1] == 0x38) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1050     ) {
1051     value = BURST_VALUES_800;
1052     value_true = 1;
1053 } else if((rx_char[position+1] == 0x37) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1054     ) {
1055     value = BURST_VALUES_750;
1056     value_true = 1;
1057 } else if((rx_char[position+1] == 0x37) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1058     ) {
1059     value = BURST_VALUES_700;
1060     value_true = 1;
1061 } else if((rx_char[position+1] == 0x36) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1062     ) {
1063     value = BURST_VALUES_650;
1064     value_true = 1;
1065 }
```

```

1054         } else if((rx_char[position+1] == 0x36) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1055             ) {
1056             value = BURST_VALUES_600;
1057             value_true = 1;
1058         } else if((rx_char[position+1] == 0x35) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1059             ) {
1060             value = BURST_VALUES_550;
1061             value_true = 1;
1062         } else if((rx_char[position+1] == 0x35) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1063             ) {
1064             value = BURST_VALUES_500;
1065             value_true = 1;
1066         } else if((rx_char[position+1] == 0x34) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1067             ) {
1068             value = BURST_VALUES_450;
1069             value_true = 1;
1070         } else if((rx_char[position+1] == 0x34) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1071             ) {
1072             value = BURST_VALUES_400;
1073             value_true = 1;
1074         } else if((rx_char[position+1] == 0x33) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1075             ) {
1076             value = BURST_VALUES_350;
1077             value_true = 1;
1078         } else if((rx_char[position+1] == 0x33) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1079             ) {
1080             value = BURST_VALUES_300;
1081             value_true = 1;
1082         } else if((rx_char[position+1] == 0x32) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1083             ) {
1084             value = BURST_VALUES_250;
1085             value_true = 1;
1086         } else if((rx_char[position+1] == 0x32) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1087             ) {
1088             value = BURST_VALUES_200;
1089             value_true = 1;
1090         } else if((rx_char[position+1] == 0x31) && (rx_char[position+2] == 0x35) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1091             ) {
1092             value = BURST_VALUES_150;
1093             value_true = 1;
1094         } else if((rx_char[position+1] == 0x31) && (rx_char[position+2] == 0x30) && (rx_char[position+3] == 0x30)
1095             ) {
1096             value = BURST_VALUES_100;
1097             value_true = 1;
1098         } else if((rx_char[position+1] == 0x35) && (rx_char[position+2] == 0x30)) {
1099             value = BURST_VALUES_50;
1100             value_true = 1;
1101         }
1102     }
1103
1104     if ((frequency_true) && (value_true)) {
1105         UARTprintf("Burst has start!\n");
1106         burst_start(burst_freq, value);
1107         UARTprintf("Burst has end!\n");
1108     } else if (frequency_true == 0) {
1109         UARTprintf("\n***** ERROR *****\n");
1110         UARTprintf("Frequency is not valid!\nValid frequencys are:\n");
1111         UARTprintf("10000Hz 8000Hz\n 6000Hz 4000Hz\n 2000Hz 1000Hz\n 950Hz 900Hz\n 850Hz 800Hz\n 750Hz 700\n
1112             Hz\n 650Hz 600Hz\n 550Hz 500Hz\n 450Hz 400Hz\n 350Hz 300Hz\n 250Hz 200Hz\n 150Hz 100Hz\n
1113             50Hz\n");
1114         UARTprintf("\nFor example: A burst measurement with a frequency of\n1000Hz an 700 values type the
1115             follow command in the command line:\n");
1116         UARTprintf("burst(1000,700)\n");
1117         UARTprintf("\n***** ERROR *****\n");
1118     } else if (value_true == 0) {
1119         UARTprintf("\n***** ERROR *****\n");
1120         UARTprintf("Number of values are not valid!\nValid values are:\n");
1121         UARTprintf("1.000\n900\n850\n800\n750\n700\n650\n600\n550\n500\n450\n400\n350\n300\n250\n200\n150\n
1122             n100\n50\n");
1123         UARTprintf("\nFor example: A burst measurement with a frequency of\n1000Hz an 700 values type the
1124             follow command in the command line:\n");
1125         UARTprintf("burst(1000,700)\n");
1126         UARTprintf("\n***** ERROR *****\n");
1127     }
1128 };
1129
1130 } break;
1131
1132 //*****
1133 // get_burst(ADDRESS OF THE SENSOR)
1134 // returns the burst data of the cell sensor
1135 //*****
1136 case GET_BURST: {
1137     uint8_t frame_number = 0;
1138     uint16_t volt_msb = 0;
1139     uint16_t volt_lsb = 0;
1140     uint16_t index = 0;

```

```

1123     uint16_t gain = 0;
1124
1125     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
1126
1127
1128     // rx_char[12] and rx_char[13] are the address of the sensor
1129     packet[0] = char_to_hex(rx_char[10], rx_char[11]);
1130     packet[1] = COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RQ;
1131     packet[2] = 0x00;
1132     packet[3] = 0x00;
1133
1134     tx_data_length = 0; // Normal Data length
1135     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
1136
1137     rx_data_length = 0; // Normal Data length
1138     rx_packet(HEADER_LENGTH + rx_data_length); // Config CC1101 for data receive
1139
1140     // Check if the timeout flag is set
1141     if (TIMEOUT_IS_SET) {
1142         UARTprintf("No answer from sensor 0x%x!\n", packet[0]);
1143     } else {
1144
1145         frame_counter = rx_data[2];
1146         rx_data_length = rx_data[3];
1147         seq_number = 0; // Sequenznummer zurücksetzen
1148
1149         if (frame_counter == 0)
1150             UARTprintf("The sensor has answer, but there are no burst data available on sensor 0x%x!\n",
1151                 packet[0]);
1152
1153         for (frame_number = 0; frame_number < frame_counter; frame_number++) {
1154             delay_ms(100); // wait before the next package is send
1155
1156             // rx_char[12] and rx_char[13] are the address of the sensor
1157             packet[0] = char_to_hex(rx_char[10], rx_char[11]);
1158             packet[1] = COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RX;
1159             packet[2] = frame_number;
1160             packet[3] = 0x00;
1161
1162             tx_data_length = 0;
1163             tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet);
1164
1165             // The rx_data_length ist set from the sensor after the burst data request
1166             rx_packet(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
1167
1168             // Check if the timeout flag is set
1169             if (TIMEOUT_IS_SET) {
1170                 UARTprintf("Connection lost to sensor 0x%x!\n", packet[0]);
1171             } else {
1172                 index = 0;
1173                 // Decode the volage information form the sensor
1174                 for (seq_number = 0; seq_number <= rx_data_length; seq_number++) {
1175
1176                     gain = (rx_data[2] << 8) & 0x0F00;
1177                     gain |= (rx_data[3] << 0) & 0xFF;
1178
1179                     if ((rx_data[2] >> 4) == 0x00) { // 12 Bit ADC
1180                         // BEGIN For 12 bit ADC
1181                         *****
1182                         volt_msb = (((uint16_t)(rx_data[HEADER_LENGTH + seq_number] & 0xFF)) << 8) & 0xFF00;
1183                         seq_number++;
1184                         volt_lsb = (((uint16_t)(rx_data[HEADER_LENGTH + seq_number] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
1185
1186                         burst_data[index] = volt_msb | volt_lsb;
1187                         // END For 12 bit ADC
1188                         *****
1189                     } else {
1190                         // For testing AD7691 BEGIN
1191                         *****
1192                         volt_msb = (((uint16_t)(rx_data[HEADER_LENGTH + seq_number] & 0xFF)) << 8) & 0xFF00;
1193                         seq_number++;
1194                         volt_lsb = (((uint16_t)(rx_data[HEADER_LENGTH + seq_number] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
1195
1196                         burst_data[index] = (volt_msb | volt_lsb); // for AD7691 testing on the cell sensor
1197                         21.01.15 NS
1198                         burst_data[index] = burst_data[index] << 2; // for AD7691 testing on the cell sensor
1199                         21.01.15 NS
1200                         // For testing AD7691 END
1201                         *****
1202                     }
1203                 }
1204                 index++;
1205             }
1206         }
1207         // Print the burst data
1208         for (index = 0; index < (rx_data_length/2); index++)
1209             //UARTprintf("Frame: %i Nr: %i Value: %i\n", frame_number, index, burst_data[index]);

```

```

1201         UARTprintf("%i ", burst_data[index]);
1202     }
1203 }
1204 UARTprintf("Gain: 0x%x \n", gain);
1205
1206 UARTprintf("Printing the current data\n");
1207
1208 for (index = 0; index < asynch_counter; index++)
1209     UARTprintf("%i ", burst_current[index]);
1210
1211 UARTprintf("\nSending burst data has end\n\n", packet[0]);
1212
1213 }
1214
1215 } break;
1216
1217 //*****
1218 // cali_burst(ADDRESS OF THE CELL SENSOR)
1219 // calibrate mode to detect the delay time between the base station and the cell sensor
1220 //*****
1221 case CALI_BURST: {
1222     uint32_t spiSendData[2];
1223     uint16_t time_zs = 0;
1224
1225     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
1226
1227     GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00); // Testpin
1228     //B4_ON;
1229     packet[0] = BROADCAST;
1230     packet[1] = COMMAND_CALI_BURST;
1231     packet[2] = 0;
1232     packet[3] = 0;
1233
1234     tx_data_length = 0; // Normal Data length
1235     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
1236     //B4_OFF;
1237
1238     /*** Grundeinstellungen *****/
1239     // GDO0 ist Output und GDO2 ist Input
1240     CC1101_GDO2_IRQ_DISABLE;
1241     CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ;
1242     CC1101_GDO2_IRQ_FALLING_EDGE; // IRQ is trigger on a falling egde
1243
1244     CC1101_GDO0_SET_OUTPUT; // GDO0 is an output
1245     CC1101_GDO0_SET_HIGH; // Set GDO0 on high
1246
1247     IRQ_SET_CALI_BURST; // Auf den ersten IRQ warten
1248     RX_CALI_SET; // RX Flag setzen
1249     /*** *****/
1250     // CC1101 Konfigurieren
1251     cc1101_reset(); // Reset all registers to their default values and go to idle state
1252     cc1101_config_burst_cali(); // Configure the transceiver for sending the wakeup signal
1253     TIMER2config(); // Timer to messure the triggerspace
1254     /*** Puls senden *****/
1255
1256     spiSendData[0] = CC1101_CS_STX;
1257     SPI_send_data(1, spiSendData);
1258
1259     B4_ON;
1260     delay_ms(50); // Timer till the sensor is ready (6ms)
1261     /*** AB HIER GEHT ES LOS *****/
1262     CC1101_GDO0_SET_LOW;
1263     GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF); // Testpin
1264     TIMER2_START; // Start timer 2
1265
1266     /*** Puls empfangen *****/
1267     spiSendData[0] = CC1101_CS_SIDLE;
1268     SPI_send_data(1, spiSendData);
1269
1270     spiSendData[0] = CC1101_CS_SRX;
1271     SPI_send_data(1, spiSendData);
1272     delay_us(1800); // 1
1273
1274
1275     CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ; // GDO2 Clear
1276     CC1101_GDO2_IRQ_ENABLE; // GDO2 Enable
1277     while(RX_CALI_IS_SET); // Warten bis Impuls empfangen wurde
1278
1279     cc1101_reset(); // Reset all registers to their default values and go to idle state
1280     rx_data_length = 2; // Normal Data length
1281     rx_packet(HEADER_LENGTH + rx_data_length); // Config CC1101 for data receive
1282
1283     if (TIMEOUT_IS_SET) {
1284         UARTprintf("Connection lost to sensor 0x%x!\n", packet[0]);
1285     } else {

```



```

1286
1287         time_zs = 0xFFFF;
1288         time_zs = (rx_data[4] << 8) & 0xFF00;
1289         time_zs |= (rx_data[5] << 0) & 0x00FF;
1290
1291         UARTprintf(" Laufzeit: %i\n", adc_value[0]);
1292         UARTprintf(" Laufzeit: %i\n", time_zs);
1293
1294         packet[0] = BROADCAST;
1295         packet[1] = COMMAND_DOWNLINK_BURST_CHECK;
1296         packet[2] = 0x00;
1297         packet[3] = 0x00;
1298     };
1299
1300     tx_data_length = 0;
1301     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Normal Data length
1302 // Config CC1101 for data tranceive
1303
1304
1305 } break;
1306
1307 //*****
1308 // cali_clk (ADDRESS OF THE SENSOR)
1309 // calibrate mode to detect the delay time between the base station and the cell sensor
1310 //*****
1311 case CALL_CLK: {
1312     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
1313
1314     uint32_t frequency = 0;
1315     uint32_t index = 0;
1316
1317     packet[0] = BROADCAST;
1318     packet[1] = COMMAND_CALL_CLK;
1319     packet[2] = 0;
1320     packet[3] = 0;
1321
1322     tx_data_length = 0;
1323     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Normal Data length
1324 // Config CC1101 for data tranceive
1325
1326 do{ // Schleife wird solange ausgeführt bis Takt ok ist
1327     //*** Grundeinstellungen ****
1328     // GDO0 ist Output und GDO2 ist Input
1329     CC1101_GDO2_IRQ_DISABLE;
1330     CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ;
1331     CC1101_GDO2_IRQ_FALLING_EDGE; // IRQ is trigger on a falling egde
1332
1333     CC1101_GDO0_SET_OUTPUT; // GDO0 is an output
1334     CC1101_GDO0_SET_HIGH; // Set GDO0 on high
1335
1336     //***Takt synchronisierung ****
1337
1338     TIMER2config(); // Timer to measure the triggerspace
1339     ccl1101_reset(); // Reset all registers to their default values and go to idle state
1340     ccl1101_config_cali_clk(); // Configure the transceiver for sending the wakeup signal
1341     ccl1101_rx_asynchronous_mode(); // Ab hier wird empfangen
1342     IRQ_SET_GDO2_CLOCK_CALL_START; // IRQ setzen
1343     CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ; // GDO2 clear
1344     delay_ms(40); // Wait untill sensor is ready and TX signal
1345     timeout_start(tx_timeout); // Start the timeout timer
1346     CC1101_GDO2_IRQ_ENABLE; // GDO2 enable
1347
1348     while((clk_cali_counter <= clk_num counts + 5) && (!TIMEOUT_IS_SET)); // collect values
1349
1350     timeout_stop(); // Stop the timeout mode
1351     clk_cali_counter = 0;
1352     ccl1101_reset();
1353     TIMER2_STOP;
1354
1355     CC1101_GDO0_SET_INPUT; // GDO0
1356
1357     frequency = 0;
1358     UARTprintf("-----\n");
1359     for(index = 1; index != clk_num counts + 1; index++) { // Alle adc Werte zusammenrechnen
1360         UARTprintf("%i\n", adc_value[index]);
1361         frequency = frequency + adc_value[index];
1362     }
1363     UARTprintf("-----\n");
1364
1365     frequency = frequency / clk_num counts; // Durchschnitt errechnen
1366
1367     UARTprintf("%i\n", frequency);
1368     UARTprintf("-----\n");
1369
1370     // Ist der durchschnitt der 20 Werte innerhalb der toleranz?

```

```

1371         // Gemessen werden 2ms. Dies entspricht einem Wert von 240.000
1372         // 16.000/((240.000/120*10^6)/2) = 16MHz
1373         // Toleranz wird nun auf +- 1MHz festgelegt
1374         // das heit +- 1509, also 241.509 bzw. 238.491
1375
1376         packet[0] = BROADCAST;
1377         packet[1] = COMMAND_CLK_OK;
1378
1379         if(frequency >= 240200) // Frequency is to low
1380             packet[1] = COMMAND_CLK_UP;
1381         else if(frequency <= 239800) // Frequency is to high
1382             packet[1] = COMMAND_CLK_DOWN;
1383
1384         packet[2] = 0;
1385         packet[3] = 0;
1386
1387         delay_ms(200);
1388
1389         tx_data_length = 0; // Normal Data length
1390         tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
1391
1392     } while(packet[1] != COMMAND_CLK_OK);
1393
1394 } break;
1395
1396 //*****
1397 // AD5270 test mode for the basestation.
1398 //*****
1399 case SET_AD5270_BS: {
1400     uint16_t res_value = 0;
1401     uint16_t res_value1 = 0;
1402     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
1403
1404     // Initialize the SPI
1405     SPIinit(spiBitRate, spiBit, SSI_FRF_MOTO_MODE_1);
1406
1407     // Convert the input char values into hex values
1408     res_value = char_to_hex3(rx_char[14], rx_char[15], rx_char[16]);
1409     res_value1 = char_to_hex3(rx_char[18], rx_char[19], rx_char[20]);
1410
1411     write_AD5270_1(res_value);
1412     write_AD5270_2(res_value1);
1413
1414     UARTprintf("Setting the AD5270 on the basestation: 0x%x and 0x%x\n", res_value, res_value1);
1415
1416     // Initialize the SPI
1417     SPIinit(spiBitRate, spiBit, SSI_FRF_MOTO_MODE_0);
1418
1419 } break;
1420
1421 //*****
1422 // AD5270 test mode for the cellsensor.
1423 //*****
1424 case SET_AD5270_ZS: {
1425     uint16_t res_value = 0;
1426     uint16_t res_value1 = 0;
1427     uint8_t upper_byte = 0;
1428     uint8_t lower_byte = 0;
1429     uint8_t zs_address = 0;
1430
1431     uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
1432
1433     // Convert the input char values into hex values
1434     zs_address = char_to_hex(rx_char[14], rx_char[15]);
1435     res_value = char_to_hex3(rx_char[17], rx_char[18], rx_char[19]);
1436     res_value1 = char_to_hex3(rx_char[21], rx_char[22], rx_char[23]);
1437
1438     upper_byte = (res_value >> 8);
1439     lower_byte = (res_value >> 0);
1440
1441     packet[0] = zs_address;
1442     packet[1] = COMMAND_AD5270_1;
1443     packet[2] = upper_byte;
1444     packet[3] = lower_byte;
1445
1446     tx_data_length = 0; // Normal Data length
1447     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
1448
1449     delay_ms(500);
1450
1451     upper_byte = (res_value1 >> 8);
1452     lower_byte = (res_value1 >> 0);
1453
1454     packet[0] = zs_address;

```

```
1456     packet[1] = COMMAND_AD5270_2;
1457     packet[2] = upper_byte;
1458     packet[3] = lower_byte;
1459
1460     tx_data_length = 0; // Normal Data length
1461     tx_packet(HEADER_LENGTH + tx_data_length, packet); // Config CC1101 for data tranceive
1462
1463     UARTprintf("Setting the AD5270 on the cellsensor 0x%x: 0x%x and 0x%x\n", zs_adress, res_value, res_value1);
1464
1465     } break;
1466
1467     //*****
1468     // Error,
1469     //*****
1470     default: {
1471         UARTprintf("ERROR!\n");
1472         uart_rx_flag = 0; // Reset the UART flag
1473     } break;
1474 }
1475 }
1476 }
```

```

1  /*****
2  **   File name       : spi.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 06/06/2014
5  **   Last Update     : 27/07/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : SPI function
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/uart.h"
28 #include "header/interrupts.h"
29 #include "header/CC1101.h"
30
31
32 void SPIinit(uint32_t spiBitRate, uint8_t spiBit, uint32_t spiConfig) {
33
34     // The SSI3 peripheral must be enabled for use.
35     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI3);
36
37     // The GPIOQ peripheral must be enabled for use.
38     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ);
39
40     // Configure the pin muxing.
41     GPIOPinConfigure(GPIO_PQ0_SSI3CLK);
42     // GPIOPinConfigure(GPIO_PQ1_SSI3FSS);
43     GPIOPinConfigure(GPIO_PQ2_SSI3XDAT0);
44     GPIOPinConfigure(GPIO_PQ3_SSI3XDAT1);
45
46
47     // Configure the GPIO settings for the SSI pins.
48     //   PQ2 – SSI3Tx   MOSI
49     //   PQ3 – SSI3Rx   MISO
50     //   PQ1 – SSI3Fss  Chip select
51     //   PQ0 – SSI3CLK  CLK
52     GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
53
54     // Configure and enable the SSI port for SPI master mode. Use SSI0,
55     // system clock supply, idle clock level low and active low clock in
56     // freescale SPI mode, master mode, 1MHz SSI frequency, and 8-bit data.
57     // For SPI mode, you can set the polarity of the SSI clock when the SSI
58     // unit is idle. You can also configure what clock edge you want to
59     // capture data on. Please reference the datasheet for more information on
60     // the different SPI modes.
61     SSIConfigSetExpClk(SSI3_BASE, SysCtlClockGet(), spiConfig, SSI_MODE_MASTER, spiBitRate, spiBit);
62
63     // Enable the SSI3 module.
64     SSIEnable(SSI3_BASE);
65 }
66
67 void SPI_send_data(int length, uint32_t data[10]) {
68     int index = 0;
69
70     CS_ENABLE;
71
72     for(index = 0; index < length; index++) {
73         SSIDataPut(SSI3_BASE, data[index]);
74
75         // Wait until SSI3 is done transferring all the data in the transmit FIFO.
76         while(SSIBusy(SSI3_BASE));
77     }
78     CS_DISABLE;
79 }

```

```

1  /*****
2  **   File name       : timer.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 16/05/2014
5  **   Last Update     : 27/07/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Timer function
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "driverlib/debug.h"
15 #include "driverlib/gpio.h"
16 #include "driverlib/interrupt.h"
17 #include "driverlib/pin_map.h"
18 #include "driverlib/rom.h"
19 #include "driverlib/rom_map.h"
20 #include "driverlib/sysctl.h"
21 #include "driverlib/uart.h"
22 #include "driverlib/timer.h"
23 #include "utils/uartstdio.h"
24 #include "header/timer.h"
25 #include "header/ccl101.h"
26
27 //*****
28 // System clock rate in Hz.
29 //*****
30 extern uint32_t g_ui32SysClock;
31 extern volatile uint8_t irq_delay_flag;
32
33 extern volatile uint8_t irq_timer0_mode;
34 extern volatile uint8_t irq_timer1_mode; // Flag for the timer1 mode
35 extern volatile uint8_t irq_timeout; // Flag for the time out timer
36
37 extern volatile uint32_t burst_config;
38
39 void TIMER0init(){
40     // Enable the peripherals used by this example.
41     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
42
43     UARTprintf("TIMER0 initialization done...\n");
44 }
45
46 void TIMER1init(){
47     // Enable the peripherals used by this example.
48     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);
49
50     UARTprintf("TIMER1 initialization done...\n");
51 }
52
53 void TIMER2init(){
54     // Enable the peripherals used by this example.
55     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2);
56
57     UARTprintf("TIMER2 initialization done...\n");
58 }
59 //*****
60 // Function to config the Timer0
61 // Timer0 is the counter for the delay function
62 // Timer is in ms
63 //*****
64 void TIMER0config_ms(uint32_t config){
65     // Configure the two 32-bit one shot timers.
66     ROM_TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_ONE_SHOT);
67     ROM_TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, (g_ui32SysClock/1000)*config );
68
69     // Setup the interrupts for the timer timeouts.
70     ROM_IntEnable(INT_TIMER0A);
71     ROM_TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
72
73     // Enable the timer 0.
74     TIMER0_START;
75 }
76
77 //*****
78 // Function to config the Timer0
79 // Timer0 is the counter for the delay function
80 // Timer is in us
81 //*****
82 void TIMER0config_us(uint32_t config){
83     // Configure the two 32-bit one shot timers.
84     ROM_TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_ONE_SHOT);
85     ROM_TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, (g_ui32SysClock/1000000)*config );

```

```

86
87 // Setup the interrupts for the timer timeouts.
88 ROM_IntEnable(INT_TIMER0A);
89 ROM_TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
90
91 // Enable the timer 0.
92 TIMER0_START;
93 }
94
95 //*****
96 // Function to config the Timer1
97 // Timer1 is for the burst function
98 // Time is in us
99 //*****
100 void TIMER1config(uint32_t config) {
101
102     burst_config = config;
103     TIMER1_MODE_SET_BURST; // Set flag to burst mode
104
105     // Configure the two 32-bit periodic timers.
106     ROM_TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
107     ROM_TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, (g_ui32SysClock/1000000)*10000);
108
109     // Setup the interrupt
110     ROM_IntEnable(INT_TIMER1A);
111     ROM_TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
112
113     // Enable the timer 1.
114     TIMER1_START;
115 }
116
117 //*****
118 // Function to config the Timer1
119 // Timer1 is for the LTC2376 test sampling mode
120 // Time is in us
121 //*****
122 void TIMER1config_LTC2376(uint32_t config) {
123
124     TIMER1_MODE_SET_LTC2376; // Set flag to LTC2376 sampling mode
125
126     // Configure the two 32-bit periodic timers.
127     ROM_TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
128     ROM_TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, (g_ui32SysClock/1000000)*config);
129
130     // Setup the interrupt
131     ROM_IntEnable(INT_TIMER1A);
132     ROM_TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
133
134     // Enable the timer 1.
135     TIMER1_START;
136 }
137
138 //*****
139 // Function to config the Timer1
140 // Timer1 is for the AD7691 test sampling mode
141 // Time is in us
142 //*****
143 void TIMER1config_AD7691(uint32_t config) {
144
145     TIMER1_MODE_SET_AD7691; // Set flag to AD7691 sampling mode
146
147     // Configure the two 32-bit periodic timers.
148     ROM_TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
149     ROM_TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, (g_ui32SysClock/1000000)*config);
150
151     // Setup the interrupt
152     ROM_IntEnable(INT_TIMER1A);
153     ROM_TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
154
155     // Enable the timer 1.
156     TIMER1_START;
157 }
158
159 //*****
160 // Function to config the Timer1
161 // Timer1 is for the AD7176 test sampling mode
162 // Time is in us
163 //*****
164 void TIMER1config_AD7176(uint32_t config) {
165
166     TIMER1_MODE_SET_AD7176; // Set flag to AD7176 sampling mode
167
168     // Configure the two 32-bit periodic timers.
169     ROM_TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
170     ROM_TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, (g_ui32SysClock/1000000)*config);

```

```
171
172 // Setup the interrupt
173 ROM_IntEnable(INT_TIMER1A);
174 ROM_TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
175
176 // Enable the timer 1.
177 TIMER1_START;
178 }
179
180 //*****
181 // Function to config the Timer2
182 // Timer to measure the triggerspace of the DCO calibration
183 //*****
184 void TIMER2config() {
185
186 // Configure the two 32-bit periodic timers.
187 ROM_TimerConfigure(TIMER2_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
188 ROM_TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, g_ui32SysClock);
189
190 //ROM_TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, g_ui32SysClock);
191 }
192
193 // Delay function in ms
194 void delay_ms(uint32_t ms){
195     TIMER_MODE_SET_DELAY;
196     irq_delay_flag = 0;
197     TIMER0config_ms(ms);
198
199     while(!irq_delay_flag);
200 }
201
202 // Delay function in us
203 void delay_us(uint32_t us){
204     TIMER_MODE_SET_DELAY;
205     irq_delay_flag = 0;
206     TIMER0config_us(us);
207
208     while(!irq_delay_flag);
209 }
210
211 // Timeout function
212 void timeout_start(uint32_t ms){
213     TIMER_MODE_SET_TIMEOUT;
214     TIMEOUT_UNSET;
215     TIMER0config_ms(ms);
216
217     // while(!TIMEOUT_IS_SET);
218 }
219
220 void timeout_stop() {
221     TIMER_MODE_SET_DELAY;
222
223     // Disable the timers.
224     ROM_TimerDisable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
225
226 }
```

```

1  /*****
2  **   File name       : uart.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 14/09/2014
5  **   Last Update     : 27/07/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : UART function
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "driverlib/debug.h"
15 #include "driverlib/gpio.h"
16 #include "driverlib/interrupt.h"
17 #include "driverlib/pin_map.h"
18 #include "driverlib/rom.h"
19 #include "driverlib/rom_map.h"
20 #include "driverlib/sysctl.h"
21 #include "driverlib/uart.h"
22 #include "utils/uartstdio.h"
23 #include "header/uart.h"
24
25 //*****
26 // Declared extern variable
27 //*****
28 extern uint32_t g_ui32SysClock;
29
30 //*****
31 // Send a string to the UART.
32 //*****
33 void
34 UARTSend(const uint8_t *pui8Buffer, uint32_t ui32Count)
35 {
36     GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 1);
37
38     // Loop while there are more characters to send
39     while(ui32Count-->0)
40     {
41         // Write the next character to the UART
42         ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *pui8Buffer++);
43
44         // Delay for 1 millisecond, necessary because UART Baud rate is too slow
45         SysCtlDelay(g_ui32SysClock / (1000 * 3));
46     }
47     GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
48 }
49
50
51 void UARTInit(uint32_t port_num, uint32_t data_rate, uint32_t clock_rate){
52
53     // Enable the GPIO Peripheral used by the UART
54     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
55
56     // Enable UART0
57     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
58
59     // Configure GPIO Pins for UART mode
60     ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
61     ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
62     ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
63
64     // Enable the UART interrupt
65     ROM_IntEnable(INT_UART0);
66     ROM_UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
67
68     UARTFIFODisable(UART0_BASE);
69
70     // Initialize the UART
71     UARTStdioConfig(port_num, data_rate, clock_rate);
72
73     UARTprintf("System initialization done...\n");
74     UARTprintf("UART initialization done...\n");
75
76 }

```



```

1  /*****
2  **   File name       : uart_check.c
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 15/09/2014
5  **   Last Update    : 27/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : UART check function
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_ints.h"
13 #include "inc/hw_memmap.h"
14 #include "inc/hw_types.h"
15 #include "driverlib/debug.h"
16 #include "driverlib/fpu.h"
17 #include "driverlib/ssi.h"
18 #include "driverlib/gpio.h"
19 #include "driverlib/interrupt.h"
20 #include "driverlib/pin_map.h"
21 #include "driverlib/rom.h"
22 #include "driverlib/rom_map.h"
23 #include "driverlib/sysctl.h"
24 #include "driverlib/timer.h"
25 #include "driverlib/uart.h"
26 #include "utils/uartstdio.h"
27 #include "header/main.h"
28 #include "header/uart.h"
29 #include "header/spi.h"
30 #include "header/timer.h"
31 #include "header/interrupts.h"
32 #include "header/CC1101.h"
33 #include "header/gpio.h"
34 #include "header/convert.h"
35 #include "header/uart_check.h"
36
37 extern volatile uint8_t rx_uart;
38 extern volatile uint8_t uart_rx_flag;
39 extern volatile unsigned char rx_char[30];
40
41 uint8_t check_input() {
42     uint8_t check = 0;
43     switch(rx_uart) {
44         /***/
45         // "help" Open the help menue
46         /***/
47         case HELP: {
48             if ((rx_char[0] == 0x68) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x6c) && (rx_char[3] == 0x70))
49                 check = 1;
50
51         } break;
52         /***/
53         case WHY: {
54
55         } break;
56         /***/
57         case GET_VOLTAGE: {
58             if ((rx_char[0] == 0x67) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
59                 (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x76) && (rx_char[5] == 0x6F) &&
60                 (rx_char[6] == 0x6C) && (rx_char[7] == 0x74) && (rx_char[8] == 0x61) &&
61                 (rx_char[9] == 0x67) && (rx_char[10] == 0x65) && (rx_char[11] == 0x28) &&
62                 (rx_char[14] == 0x29)) {
63                 check = 1;
64             } else {
65                 UARTprintf("Unknow command!\n");
66                 UARTprintf("For getting an voltage of an sensor , please type for example: get_voltage(02) for the
67                     voltage of sensor 0x02\n");
68             }
69         } break;
70         /***/
71         // "send_hex" sends four hex values with the cc1101
72         // Example: send_hex(00 04 00 00) -> sends the hex values "0x00 0x04 0x00 0x00"
73         /***/
74         case SEND_HEX: {
75             if ((rx_char[0] == 0x73) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x6E) &&
76                 (rx_char[3] == 0x64) && (rx_char[4] == 0x5F) && (rx_char[5] == 0x68) &&
77                 (rx_char[6] == 0x65) && (rx_char[7] == 0x78) && (rx_char[8] == 0x28) &&
78                 (rx_char[11] == 0x20) && (rx_char[14] == 0x20) && (rx_char[17] == 0x20) &&
79                 (rx_char[20] == 0x29)) {
80                 check = 1;
81             } else {
82                 UARTprintf("Unknow command!\n");
83                 UARTprintf("For sending hex values to a sensor , please type the follow command to send 0xAB 0x02
84                     0x32 0x45\n");

```

```
84         UARTprintf("send_hex(AB 02 32 45)\n");
85     }
86
87     } break;
88     //*****
89     // "get_config" mode. Returns the actual config of the basestation
90     //*****
91     case GET_CONFIG_BS: {
92         if ((rx_char[0] == 0x67) && (rx_char[1] == 0x65) && (rx_char[2] == 0x74) &&
93             (rx_char[3] == 0x5F) && (rx_char[4] == 0x63) && (rx_char[5] == 0x6F) &&
94             (rx_char[6] == 0x6E) && (rx_char[7] == 0x66) && (rx_char[8] == 0x69) &&
95             (rx_char[9] == 0x67)) {
96             check = 1;
97         } else {
98             UARTprintf("Unknow command!\n");
99             UARTprintf("For getting the configuration of the basestation , please type:\n");
100            UARTprintf("get_config(00)\n");
101        }
102    } break;
103    //*****
104    // "set_brake" mode.
105    //*****
106    case SET_BRATE: {
107
108    } break;
109    //*****
110    // Burstmode. Detect the frequency and the number of values and start the burst mode
111    //*****
112    case BURST: {
113
114
115    } break;
116
117    default: {
118        UARTprintf("ERROR!\n");
119        uart_rx_flag = 0;
120    } break;
121
122    }
123    return check;
124 }
```

```

1  /*****
2  **   File name       : AD5270.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 11/02/2015
5  **   Last Update    : 17/07/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : AD5270
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef AD5270_H_
11 #define AD5270_H_
12
13 #define AD5270_NOP_CMD          0x0000
14 #define AD5270_WRITE_CMD       0x0400
15 #define AD5270_READ_CMD        0x0800
16 #define AD5270_STORE_CMD       0x0C00
17 #define AD5270_SW_RST_CMD      0x1000
18 #define AD5270_SW_SHD_ON_CMD   0x2401
19
20 // Definition for the SYNC Output
21 #define AD5270_CS1_OUTPUT      ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);\
22                               ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1)
23
24 #define AD5270_CS2_OUTPUT      ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);\
25                               ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_2)
26
27 #define AD5270_CS1_ENABLE      GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00)
28 #define AD5270_CS1_DISABLE    GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF)
29
30 #define AD5270_CS2_ENABLE      GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00)
31 #define AD5270_CS2_DISABLE    GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_2, 0xFF)
32
33 // Declare the prototype functions
34 void write_AD5270_1(uint16_t);
35 void write_AD5270_2(uint16_t);
36 void ctr_voltage_AD5270(uint16_t);
37
38 #endif /* AD5270_H_ */

```

```

1  /*****
2  **   File name       : AD7176.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 14/01/2015
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : AD7176
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef AD7176_H_
11 #define AD7176_H_
12
13 #define COMMS                  0x00
14 #define STATUS                 0x00
15 #define ADCMODE                0x01
16 #define IFMODE                 0x02
17 #define REGCHECK               0x03
18 #define DATA                  0x04
19 #define GPIOCON                0x06
20 #define ID                     0x07
21 #define CHMAP0                 0x10
22 #define CHMAP1                 0x11
23 #define CHMAP2                 0x12
24 #define CHMAP3                 0x13
25 #define SETUPCON0              0x20
26 #define SETUPCON1              0x21
27 #define SETUPCON2              0x22
28 #define SETUPCON3              0x23
29 #define FILTCON0               0x28
30 #define FILTCON1               0x29
31 #define FILTCON2               0x2A
32 #define FILTCON3               0x2B
33 #define OFFSET0                0x30
34 #define OFFSET1                0x31
35 #define OFFSET2                0x32
36 #define OFFSET3                0x33
37 #define GAIN0                  0x38
38 #define GAIN1                  0x39
39 #define GAIN2                  0x3A
40 #define GAIN3                  0x3B
41
42 // Definitions for the ouputs
43 #define AD7176_CS_SET_OUTPUT    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);\
44                               ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1)
45

```

```

46 #define AD7176_CS_ENABLE      GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00)
47 #define AD7176_CS_DISABLE    GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF)
48
49 // Definitions for the inputs
50 #define AD7176_BUSY_SET_INPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
51 ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
52
53 #define AD7176_BUSY_SET_OUTPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
54 ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
55
56
57 // Definitions for the AD7176 IRQ setup
58 #define AD7176_IRQ_ENABLE     GPIOIntEnable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_INT_PIN_7);\
59                               IntEnable(INT_GPIOK)
60
61 #define AD7176_IRQ_DISABLE    GPIOIntDisable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7);\
62                               IntDisable(INT_GPIOK)
63
64 #define AD7176_IRQ_FALLING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_FALLING_EDGE);
65 #define AD7176_IRQ_RISING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_RISING_EDGE);
66
67 #define AD7176_CLEAR_IRQ      GPIOIntClear(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
68
69 void init_AD7176(void);
70 void AD7176_start(uint8_t, uint8_t);
71
72 #endif /* AD7176_H_ */

```

```

1  /*****
2  **   File name      : AD7691.h
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 22/12/2015
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : AD7691
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef AD7691_H_
11 #define AD7691_H_
12
13
14 // Definitions for the ouputs
15 #define AD7691_CS_ENABLE      GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00)
16 #define AD7691_CS_DISABLE    GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF)
17
18 #define AD7691_CNV_SET_HIGH   GPIOPinWrite(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_6, 0xFF)
19 #define AD7691_CNV_SET_LOW   GPIOPinWrite(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_6, 0x00)
20
21
22 // Definitions for the inputs
23 #define AD7691_BUSY_SET_INPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
24 ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
25
26 #define AD7691_BUSY_SET_OUTPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
27 ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
28
29
30 // Definitions for the LTC2376 IRQ setup
31 #define AD7691_IRQ_ENABLE     GPIOIntEnable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_INT_PIN_7);\
32                               IntEnable(INT_GPIOK)
33
34 #define AD7691_IRQ_DISABLE    GPIOIntDisable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7);\
35                               IntDisable(INT_GPIOK)
36
37 #define AD7691_IRQ_FALLING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_FALLING_EDGE);
38 #define AD7691_IRQ_RISING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_RISING_EDGE);
39
40 #define AD7691_CLEAR_IRQ      GPIOIntClear(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
41
42 // Declare the prototype functions
43 void init_ad7691(void);
44 void ad7691_start(uint8_t, uint8_t);
45
46 #endif /* TLC2376_H_ */

```

```

1  /*****
2  **   File name      : adc.h
3  **   Hardware       : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date           : 14/09/2015
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : ADC12
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef ADC_H_

```

```

11 #define ADC_H_
12
13 void init_adc(void);
14 uint32_t read_adc(void);
15
16 #endif /* ADC_H_ */

1
2 /*****
3 ** File name      : CC1101.h
4 ** Hardware      : ARM Cortex M4 Basestation
5 ** Date          : 14/09/2015
6 ** Last Update   : 28/10/2015
7 ** Author        : Nico Sassano
8 ** Description   : CC1101
9 ** State         : Final state
10 *****/
11 #ifndef CC1101_H_
12 #define CC1101_H_
13
14 void cc1101_power_up_reset(void);
15 void tx_packet(uint8_t *, uint8_t *);
16 void rx_packet(uint8_t);
17 void cc1101_tx_asynchronous_mode(void);
18 void cc1101_rx_asynchronous_mode(void);
19 uint8_t cc1101_get_rxbytes(void);
20 void cc1101_read_rx_fifo(uint8_t *, uint8_t);
21 void cc1101_reset(void);
22 void cc1101_config_burst_tx(void);
23 void cc1101_config_burst_rx(void);
24 void cc1101_config_burst_calib(void);
25 void cc1101_config_calib_clk(void);
26 void cc1101_config_calib_burst(void);
27 void burst_start(uint8_t *, uint8_t);
28 void cc1101_idle(void);
29 void cc1101_set_tx(unsigned long brate);
30
31 extern volatile int GDO2_IRQ_MODE;
32 extern volatile char packed[6];
33 extern int state;
34 extern volatile int IRQ_TX_FLAG;
35 extern volatile int IRQ_RX_FLAG;
36 extern volatile uint8_t irq_timeout; // Flag for the time out timer
37
38 // CRC check done
39 #define CC1101_GDO0_DIR_IN (CC1101_GDO0_PxDIR &= ~CC1101_GDO0_PIN)
40 #define CC1101_GDO0_IN GPIOPinRead(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_0)
41
42 // Sync word detected
43 #define CC1101_GDO2_IRQ_ENABLE GPIOIntEnable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_INT_PIN_6);\
44 IntEnable(INT_GPIOK)
45
46 #define CC1101_GDO2_IRQ_DISABLE GPIOIntDisable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_6);\
47 IntDisable(INT_GPIOK)
48
49 #define CC1101_GDO2_IRQ_FALLING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_6, GPIO_FALLING_EDGE);
50 #define CC1101_GDO2_IRQ_RISING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_6, GPIO_RISING_EDGE);
51
52 #define CC1101_GDO2_CLEAR_IRQ GPIOIntClear(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_6)
53
54 #define HEADER_LENGTH 0x04
55 #define ADDRESS_THIS_SENSOR 0x00
56
57 /*****
58 ** IRQ Macros
59 *****/
60 #define IRQ_SET_RX (irq_mode = RX_MODE)
61 #define IRQ_IS_RX (irq_mode == RX_MODE)
62 #define IRQ_SET_TX (irq_mode = TX_MODE)
63 #define IRQ_IS_TX (irq_mode == TX_MODE)
64 #define IRQ_SET_BURST (irq_mode = BURST_MODE)
65 #define IRQ_IS_BURST (irq_mode == BURST_MODE)
66 #define IRQ_SET_CALI_BURST (irq_mode = CALI_BURST_MODE)
67 #define IRQ_IS_CALI_BURST (irq_mode == CALI_BURST_MODE)
68 #define IRQ_SET_GDO2_READY (irq_mode = GDO2_READY)
69 #define IRQ_IS_GDO2_READY (irq_mode == GDO2_READY)
70 #define IRQ_SET_GDO2_CLOCK_CALL_START (irq_mode = CLOCK_CALL_START)
71 #define IRQ_IS_GDO2_CLOCK_CALL_START (irq_mode == CLOCK_CALL_START)
72 #define IRQ_SET_GDO2_CLOCK_CALL_END (irq_mode = CLOCK_CALL_END)
73 #define IRQ_IS_GDO2_CLOCK_CALL_END (irq_mode == CLOCK_CALL_END)
74
75 /*****
76 ** Interrupt Modes
77 *****/
78 #define TX_MODE 0x00

```

```

79 #define RX_MODE 0x01
80 #define BURST_MODE 0x02
81 #define CALL_BURST_MODE 0x03
82 #define GDO2_READY 0x04
83 #define CLOCK_CALL_START 0x05
84 #define CLOCK_CALL_END 0x06
85
86 /** Downlink commands *****/
87 #define COMMAND_WAKEUP 0x00
88 #define COMMAND_WAKEUP_DONE 0x01
89 #define COMMAND_DOWNLINK_IS_AWAKE 0x02
90 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE 0x03
91 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE 0x04
92 #define COMMAND_DOWNLINK_SLEEP 0x05
93 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE 0x06
94 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE 0x07
95 #define COMMAND_DOWNLINK_BALANCING_ON 0x08
96 #define COMMAND_DOWNLINK_BALANCING_OFF 0x09
97 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE 0x0A
98 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE_TEMPERATURE 0x0B
99 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_MODE 0x0C
100 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RQ 0x0D
101 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RX 0x0E
102 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_CHECK 0x0F
103 #define COMMAND_DOWNLINK_CONFIG_SET 0x10
104 #define COMMAND_DOWNLINK_CONFIG 0x11
105 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_TMP102 0x12
106 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102 0x13
107 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_TMP102_CALI 0x14
108 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102_CALI 0x15
109 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_MSP430 0x16
110 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430 0x17
111 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_MSP430_CALI 0x18
112 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430_CALI 0x19
113 #define COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_TMP102 0x1A
114 #define COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_MSP430 0x1B
115 #define COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_ADC 0x1C
116 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE_ALL 0x1D
117 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE_TEMPERATURE_ALL 0x1E
118 #define COMMAND_CALL_BURST 0x1F
119 #define COMMAND_CLK_OK 0x21
120 #define COMMAND_CLK_UP 0x20
121 #define COMMAND_CLK_DOWN 0x22
122 #define COMMAND_CALL_CLK 0x23
123 #define COMMAND_SW 0x24
124 #define COMMAND_GOERTZEL 0x25
125 #define COMMAND_AD5270_1 0x26
126 #define COMMAND_AD5270_2 0x27
127 #define COMMAND_SET_PREPROCESSING 0x28
128 #define COMMAND_GOERTZEL_FREQ 0x29
129 #define COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ 0x2A
130 #define COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ2 0x2B
131 #define COMMAND_GOERTZEL_NUMB_PERI 0x2C
132
133 #define COMMAND_BACK_FROM_BURST 0xFD
134 #define COMMAND_WAIT 0xFE
135 #define COMMAND_DOWNLINK_UNKWOWN 0xFF
136
137 // Frequency offset added to the base frequency (in units of 1.59 kHz – 1.65 kHz)
138 #define FREQUENCY_OFFSET 6
139
140 /* Command Strobes (Table 42 in datasheet) */
141 #define cc1101_config_packet 0x30
142 #define CC1101_CS_SFSTXON 0x31
143 #define CC1101_CS_SXOFF 0x32
144 #define CC1101_CS_SCAL 0x33
145 #define CC1101_CS_SRX 0x34
146 #define CC1101_CS_STX 0x35
147 #define CC1101_CS_SIDLE 0x36
148 #define CC1101_CS_SAFC 0x37
149 #define CC1101_CS_SWOR 0x38
150 #define CC1101_CS_SPWD 0x39
151 #define CC1101_CS_SFRX 0x3A
152 #define CC1101_CS_SFTX 0x3B
153 #define CC1101_CS_SWORRST 0x3C
154 #define CC1101_CS_SNOP 0x3D
155
156 /* Configuration Registers */
157 #define CC1101_CR_IOCFG2 0x00 /* GDO2 output pin configuration */
158 #define CC1101_CR_IOCFG1 0x01 /* GDO1 output pin configuration */
159 #define CC1101_CR_IOCFG0 0x02 /* GDO0 output pin configuration */
160 #define CC1101_CR_FIFOTHR 0x03 /* RX FIFO and TX FIFO thresholds */
161 #define CC1101_CR_SYNCN1 0x04 /* Sync word, high byte */
162 #define CC1101_CR_SYNC0 0x05 /* Sync word, low byte */
163 #define CC1101_CR_PKTLEN 0x06 /* Packet length */

```

```

164 #define CC1101_CR_PKTCTRL1      0x07 /* Packet automation control */
165 #define CC1101_CR_PKTCTRL0      0x08 /* Packet automation control */
166 #define CC1101_CR_ADDR           0x09 /* Device address */
167 #define CC1101_CR_CHANNR        0x0A /* Channel number */
168 #define CC1101_CR_FSCTRL1       0x0B /* Frequency synthesizer control */
169 #define CC1101_CR_FSCTRL0       0x0C /* Frequency synthesizer control */
170 #define CC1101_CR_FREQ2         0x0D /* Frequency control word, high byte */
171 #define CC1101_CR_FREQ1         0x0E /* Frequency control word, middle byte */
172 #define CC1101_CR_FREQ0         0x0F /* Frequency control word, low byte */
173 #define CC1101_CR_MDMCFG4       0x10 /* Modem configuration */
174 #define CC1101_CR_MDMCFG3       0x11 /* Modem configuration */
175 #define CC1101_CR_MDMCFG2       0x12 /* Modem configuration */
176 #define CC1101_CR_MDMCFG1       0x13 /* Modem configuration */
177 #define CC1101_CR_MDMCFG0       0x14 /* Modem configuration */
178 #define CC1101_CR_DEVIATN       0x15 /* Modem deviation setting */
179 #define CC1101_CR_MCSM2         0x16 /* Main Radio Cntrl State Machine config */
180 #define CC1101_CR_MCSM1         0x17 /* Main Radio Cntrl State Machine config */
181 #define CC1101_CR_MCSM0         0x18 /* Main Radio Cntrl State Machine config */
182 #define CC1101_CR_FOCCFG        0x19 /* Frequency Offset Compensation config */
183 #define CC1101_CR_BSCFG         0x1A /* Bit Synchronization configuration */
184 #define CC1101_CR_AGCCTRL2      0x1B /* AGC control */
185 #define CC1101_CR_AGCCTRL1      0x1C /* AGC control */
186 #define CC1101_CR_AGCCTRL0      0x1D /* AGC control */
187 #define CC1101_CR_WOREVT1       0x1E /* High byte Event 0 timeout */
188 #define CC1101_CR_WOREVT0       0x1F /* Low byte Event 0 timeout */
189 #define CC1101_CR_WORCTRL       0x20 /* Wake On Radio control */
190 #define CC1101_CR_FREND1        0x21 /* Front end RX configuration */
191 #define CC1101_CR_FREND0        0x22 /* Front end TX configuration */
192 #define CC1101_CR_FSCAL3        0x23 /* Frequency synthesizer calibration */
193 #define CC1101_CR_FSCAL2        0x24 /* Frequency synthesizer calibration */
194 #define CC1101_CR_FSCAL1        0x25 /* Frequency synthesizer calibration */
195 #define CC1101_CR_FSCAL0        0x26 /* Frequency synthesizer calibration */
196 #define CC1101_CR_RCCTRL1       0x27 /* RC oscillator configuration */
197 #define CC1101_CR_RCCTRL0       0x28 /* RC oscillator configuration */
198 #define CC1101_CR_FSTEST        0x29 /* Frequency synthesizer cal control */
199 #define CC1101_CR_PTEST         0x2A /* Production test */
200 #define CC1101_CR_AGCTEST       0x2B /* AGC test */
201 #define CC1101_CR_TEST2         0x2C /* Various test settings */
202 #define CC1101_CR_TEST1         0x2D /* Various test settings */
203 #define CC1101_CR_TEST0         0x2E /* Various test settings */
204
205 /* Status Registers */
206
207 #define CC1101_SR_PARTNUM        0x30 /* Part number */
208 #define CC1101_SR_VERSION        0x31 /* Current version number */
209 #define CC1101_SR_FREQEST        0x32 /* Frequency offset estimate */
210 #define CC1101_SR_LQI           0x33 /* Demodulator estimate for link quality */
211 #define CC1101_SR_RSSI          0x34 /* Received signal strength indication */
212 #define CC1101_SR_MARCSTATE      0x35 /* Control state machine state */
213 #define CC1101_SR_WOR_TIME1      0x36 /* High byte of WOR timer */
214 #define CC1101_SR_WOR_TIME0      0x37 /* Low byte of WOR timer */
215 #define CC1101_SR_PKTSTATUS      0x38 /* Current GDOx status and packet status */
216 #define CC1101_SR_VCO_VC_DAC     0x39 /* Current setting from PLL cal module */
217 #define CC1101_SR_TXBYTES        0x3A /* Underflow and # of bytes in TXFIFO */
218 #define CC1101_SR_RXBYTES        0x3B /* Overflow and # of bytes in RXFIFO */
219 #define CC1101_SR_RCCTRL1_STATUS 0x3C /* Last RC oscillator calibration results */
220 #define CC1101_SR_RCCTRL0_STATUS 0x3D /* Last RC oscillator calibration results */
221
222 /* Single / Burst access */
223
224 #define CC1101_WRITE_BURST       0x40
225 #define CC1101_READ_SINGLE      0x80
226 #define CC1101_READ_BURST       0xC0
227
228 /* Memory locations */
229
230 #define CC1101_ML_PATABLE        0x3E
231 #define CC1101_ML_TXFIFO         0x3F
232 #define CC1101_ML_TXFIFO_BURST  0x7F
233 #define CC1101_ML_RXFIFO         0x3F
234
235 #define BROADCAST                 0x00
236
237 // Definitions for the CC1101 Tranceiver Board V0.4
238 #define TX_LED_ON                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00)
239 #define TX_LED_OFF                GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF)
240
241 #define RX_LED_ON                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00)
242 #define RX_LED_OFF                GPIOPinWrite(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF)
243
244 #define CS_ENABLE                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00)
245 #define CS_DISABLE                GPIOPinWrite(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF)
246
247 #define CC1101_GDO0_SET_INPUT     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH); \
248                                 ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_0)

```

```

249
250 #define CC1101_GDO0_SET_OUTPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);\
251 ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_0)
252
253 #define CC1101_GDO2_SET_INPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
254 ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_6)
255
256 #define CC1101_GDO2_SET_OUTPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
257 ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_6)
258
259 #define CC1101_GDO0_IS_HIGH GPIOPinRead(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_0) == 1
260 #define CC1101_GDO0_IS_LOW GPIOPinRead(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_0) == 0
261
262 #define CC1101_GDO0_SET_HIGH GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_0, 0xFF)
263 #define CC1101_GDO0_SET_LOW GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_0, 0x00)
264
265 #define COMMAND_REVIVED_SET command_received_flag = 1
266 #define COMMAND_REVIVED_UNSET command_received_flag = 0
267 #define COMMAND_REVIVED_IS_SET command_received_flag == 1
268 #define COMMAND_REVIVED_IS_UNSET command_received_flag == 0
269
270 #define TX_DONE_SET irq_send_done_flag = 1
271 #define TX_DONE_UNSET irq_send_done_flag = 0
272 #define TX_DONE_IS_SET irq_send_done_flag == 1
273 #define TX_DONE_IS_UNSET irq_send_done_flag == 0
274
275 #define RX_CALL_SET irq_cali_flag = 1
276 #define RX_CALL_UNSET irq_cali_flag = 0
277 #define RX_CALL_IS_SET irq_cali_flag == 1
278 #define RX_CALL_IS_UNSET irq_cali_flag == 0
279
280 /*****
281 ** Frequenzen für die Burstmessung
282 *****/
283 #define BURST_FREQ_10000HZ 0x34
284 #define BURST_FREQ_95000HZ 0x33
285 #define BURST_FREQ_90000HZ 0x32
286 #define BURST_FREQ_85000HZ 0x31
287 #define BURST_FREQ_80000HZ 0x30
288 #define BURST_FREQ_75000HZ 0x2F
289 #define BURST_FREQ_70000HZ 0x2E
290 #define BURST_FREQ_65000HZ 0x2D
291 #define BURST_FREQ_60000HZ 0x2C
292 #define BURST_FREQ_55000HZ 0x2B
293 #define BURST_FREQ_50000HZ 0x2A
294 #define BURST_FREQ_45000HZ 0x29
295 #define BURST_FREQ_40000HZ 0x28
296 #define BURST_FREQ_38000HZ 0x27
297 #define BURST_FREQ_36000HZ 0x26
298 #define BURST_FREQ_34000HZ 0x25
299 #define BURST_FREQ_32000HZ 0x24
300 #define BURST_FREQ_30000HZ 0x23
301 #define BURST_FREQ_28000HZ 0x22
302 #define BURST_FREQ_26000HZ 0x21
303 #define BURST_FREQ_24000HZ 0x20
304 #define BURST_FREQ_22000HZ 0x1F
305 #define BURST_FREQ_20000HZ 0x1E
306 #define BURST_FREQ_18000HZ 0x1C
307 #define BURST_FREQ_16000HZ 0x1B
308 #define BURST_FREQ_14000HZ 0x1A
309 #define BURST_FREQ_12000HZ 0x19
310 #define BURST_FREQ_10000HZ 0x18
311 #define BURST_FREQ_8000HZ 0x17
312 #define BURST_FREQ_6000HZ 0x16
313 #define BURST_FREQ_4000HZ 0x15
314 #define BURST_FREQ_2000HZ 0x14
315 #define BURST_FREQ_1000HZ 0x13
316 #define BURST_FREQ_950HZ 0x12
317 #define BURST_FREQ_900HZ 0x11
318 #define BURST_FREQ_850HZ 0x10
319 #define BURST_FREQ_800HZ 0x0F
320 #define BURST_FREQ_750HZ 0x0E
321 #define BURST_FREQ_700HZ 0x0D
322 #define BURST_FREQ_650HZ 0x0C
323 #define BURST_FREQ_600HZ 0x0B
324 #define BURST_FREQ_550HZ 0x0A
325 #define BURST_FREQ_500HZ 0x09
326 #define BURST_FREQ_450HZ 0x08
327 #define BURST_FREQ_400HZ 0x07
328 #define BURST_FREQ_350HZ 0x06
329 #define BURST_FREQ_300HZ 0x05
330 #define BURST_FREQ_250HZ 0x04
331 #define BURST_FREQ_200HZ 0x03
332 #define BURST_FREQ_150HZ 0x02
333 #define BURST_FREQ_100HZ 0x01

```



```

334 #define BURST_FREQ_50HZ                0x00
335
336 #define BURST_VALUES_50                 0x01
337 #define BURST_VALUES_100                0x02
338 #define BURST_VALUES_150                0x03
339 #define BURST_VALUES_200                0x04
340 #define BURST_VALUES_250                0x05
341 #define BURST_VALUES_300                0x06
342 #define BURST_VALUES_350                0x07
343 #define BURST_VALUES_400                0x08
344 #define BURST_VALUES_450                0x09
345 #define BURST_VALUES_500                0x0A
346 #define BURST_VALUES_550                0x0B
347 #define BURST_VALUES_600                0x0C
348 #define BURST_VALUES_650                0x0D
349 #define BURST_VALUES_700                0x0E
350 #define BURST_VALUES_750                0x0F
351 #define BURST_VALUES_800                0x10
352 #define BURST_VALUES_850                0x11
353 #define BURST_VALUES_900                0x12
354 #define BURST_VALUES_1000               0x13
355 #define BURST_VALUES_1500               0x14
356 #define BURST_VALUES_1900               0x15
357 #define BURST_VALUES_2000               0x16
358 #define BURST_VALUES_2500               0x17
359
360 #endif /* CC1101_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : convert.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 14/09/2015
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description     : convert
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef CONVERT_H_
11 #define CONVERT_H_
12
13 uint8_t char_to_int(char);
14 uint8_t char_to_int2(char, char);
15 uint8_t char_to_int3(char, char, char);
16 uint8_t char_to_hex(char, char);
17 uint16_t char_to_hex3(char, char, char);
18
19 #endif /* CONVERT_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : gpio.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 08/08/2014
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description     : convert
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef GPIO_H_
11 #define GPIO_H_
12
13 void GPIOinit(void);
14 void LED_test(void);
15
16 #define B4_ON      GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF)
17 #define B4_OFF    GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00)
18
19 #define LED0_ON   GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF)
20 #define LED0_OFF  GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00)
21
22 #define LED1_ON   GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0xFF)
23 #define LED1_OFF  GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0x00)
24
25 #define LED2_ON   GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF)
26 #define LED2_OFF  GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00)
27
28 #define LED3_ON   GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0xFF)
29 #define LED3_OFF  GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0x00)
30
31 #define LED_ALL_ON GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF);\
32 GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0xFF);\
33 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0xFF);\
34 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0xFF)
35
36 #define LED_ALL_OFF GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00);\
37 GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0x00);\

```

```

38         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00);\
39         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0x00)
40
41 #endif /* GPIO_H_ */

```

```

1  /*****
2  **   File name       : interrupts.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 16/05/2014
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : interrupts
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef INTERRUPTS_H_
11 #define INTERRUPTS_H_
12
13 void GDO2IntHandler(void);
14 void UARTIntHandler(void);
15 void Timer0IntHandler(void);
16 void Timer1IntHandler(void);
17
18 #endif /* INTERRUPTS_H_ */

```

```

1  /*****
2  **   File name       : interrupts.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 22/12/2014
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : interrupts
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef LTC2376_H_
11 #define LTC2376_H_
12
13 // Definitions for the outputs
14 #define LTC2376_CS_ENABLE    GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00)
15 #define LTC2376_CS_DISABLE  GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_1, 0xFF)
16
17 #define LTC2376_CNV_SET_HIGH GPIOPinWrite(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_6, 0xFF)
18 #define LTC2376_CNV_SET_LOW  GPIOPinWrite(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_6, 0x00)
19
20 // Definitions for the inputs
21 #define LTC2376_BUSY_SET_INPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
22 ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
23
24 #define LTC2376_BUSY_SET_OUTPUT ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);\
25 ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
26
27 // Definitions for the LTC2376 IRQ setup
28 #define LTC2376_IRQ_ENABLE    GPIOIntEnable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_INT_PIN_7);\
29 IntEnable(INT_GPIOK)
30
31 #define LTC2376_IRQ_DISABLE   GPIOIntDisable(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7);\
32 IntDisable(INT_GPIOK)
33
34 #define LTC2376_IRQ_FALLING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_FALLING_EDGE);
35 #define LTC2376_IRQ_RISING_EDGE GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_RISING_EDGE);
36
37 #define LTC2376_CLEAR_IRQ     GPIOIntClear(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_7)
38
39 // Declare the prototype functions
40 void init_ltc2376(void);
41 void ltc2376_start(uint8_t, uint8_t);
42
43 #endif /* LTC2376_H_ */

```

```

1  /*****
2  **   File name       : main.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 14/05/2014
5  **   Last Update    : 02/08/2015
6  **   Author         : Nico Sassano
7  **   Description    : main
8  **   State          : Final state
9  *****/
10 #ifndef MAIN_H_
11 #define MAIN_H_
12
13 #define HELP                0x00
14 #define GET_VOLTAGE         0x01
15 #define BURST               0x02
16 #define GET_BURST          0x03

```

```

17 #define GET_CONFIG_BS          0x04
18 #define SEND_HEX               0x05
19 #define SET_BRATE              0x06
20 #define CALL_BURST            0x07
21 #define CALL_CLK               0x08
22 #define MATLABMODE            0x09
23 #define LTC2376MODE           0x0A
24 #define AD7691MODE            0x0B
25 #define AD7176MODE            0x0C
26 #define SET_AD5270_BS         0x0D
27 #define SET_AD5270_ZS         0x0E
28 #define GET_CONFIG_ZS         0x0F
29 #define SET_PROPROCESSING      0x10
30 #define GET_GORTZEL           0x11
31 #define WHY                    0xEE
32
33 #endif /* MAIN_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : spi.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 06/06/2014
5  **   Last Update     : 02/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : spi
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #ifndef SPL_H_
11 #define SPL_H_
12
13 void SPIinit(uint32_t, uint8_t, uint32_t);
14 void SPI_send_data(int length, uint32_t *);
15
16 #endif /* SPI_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : convert.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 14/09/2015
5  **   Last Update     : 02/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : convert
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #ifndef CONVERT_H_
11 #define CONVERT_H_
12
13 uint8_t char_to_int(char);
14 uint8_t char_to_int2(char, char);
15 uint8_t char_to_int3(char, char, char);
16 uint8_t char_to_hex(char, char);
17 uint16_t char_to_hex3(char, char, char);
18
19 #endif /* CONVERT_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : uart.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 16/05/2014
5  **   Last Update     : 02/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : uart
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #ifndef UART_H_
11 #define UART_H_
12
13
14 void UARTSend(const uint8_t *pui8Buffer, uint32_t ui32Count);
15 void UARTTinit(uint32_t, uint32_t, uint32_t);
16
17 #endif /* UART_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : uart_check.h
3  **   Hardware        : ARM Cortex M4 Basestation
4  **   Date            : 15/09/2014
5  **   Last Update     : 02/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : uart_check
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #ifndef UART_CHECK_H_

```

```

11 #define UART_CHECK_H
12
13 uint8_t check_input(void);
14
15 #endif /* UART_CHECK_H */

1
2 /**
3 ** File name      : AD5270.c
4 ** Hardware      : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
5 ** Date          : 18/04/2015
6 ** Last Update   : 02/08/2015
7 ** Author        : Nico Sassano
8 ** Description   : AD5270
9 ** State         : Final state
10 *****/
11 #include "header/main.h"
12 /**
13 ** This function is set the AD5270 DAC
14 ** at the first OPA344 OP AMP
15 *****/
16 void write_AD5270_1(uint16_t res_value) {
17     uint16_t value = 0;
18     uint8_t upper_byte = 0;
19     uint8_t lower_byte = 0;
20
21     value = AD5270_WRITE_CMD | res_value;
22
23     upper_byte = (value >> 8);
24     lower_byte = (value >> 0);
25
26     AD5270_1_CS_PxDIR |= AD5270_1_CS_PIN;
27
28     // Enable update of the wiper position and the 50-TP memory contents through the digital interface
29     AD5270_1_CS_ENABLE;
30
31     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
32     UCA0TXBUF = 0x1C; // Send configuration mode and register
33     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
34     UCA0TXBUF = 0x03; // Send configuration mode and register
35     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
36
37     AD5270_1_CS_DISABLE;
38
39     delay_ms(1);
40
41     // Update the wiper position
42     AD5270_1_CS_ENABLE;
43
44     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
45     UCA0TXBUF = upper_byte; // Send configuration mode and register
46     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
47     UCA0TXBUF = lower_byte; // Send configuration mode and register
48     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
49
50     AD5270_1_CS_DISABLE;
51 }
52 /**
53 ** This function is set the AD5270 DAC
54 ** at the second OPA344 OP AMP
55 *****/
56 void write_AD5270_2(uint16_t res_value) {
57     uint16_t value = 0;
58     uint8_t upper_byte = 0;
59     uint8_t lower_byte = 0;
60
61     value = AD5270_WRITE_CMD | res_value;
62
63     upper_byte = (value >> 8);
64     lower_byte = (value >> 0);
65
66     AD5270_2_CS_PxDIR |= AD5270_2_CS_PIN;
67
68     // Enable update of the wiper position and the 50-TP memory contents through the digital interface
69     AD5270_2_CS_ENABLE;
70
71     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
72     UCA0TXBUF = 0x1C; // Send configuration mode and register
73     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
74     UCA0TXBUF = 0x03; // Send configuration mode and register
75     while (UCA0STAT & UCIBUSY); // Wait for TX to finish
76
77     AD5270_2_CS_DISABLE;
78
79     delay_ms(1);

```

```
80
81 // Update the wiper position
82 AD5270_2_CS_ENABLE;
83
84 while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
85 UCA0TXBUF = upper_byte; // Send configuration mode and register
86 while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
87 UCA0TXBUF = lower_byte; // Send configuration mode and register
88 while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
89
90 AD5270_2_CS_DISABLE;
91 }
```

```
1  /*****
2  **   File name       : AD7691.c
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 22/12/2014
5  **   Last Update    : 03/05/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Functions for the ADC AD7691
8  **   State           : Final state
9  *****/
10 #include "header/main.h"
11 extern volatile uint32_t AD7691_value_storage[1];
12 /*****
13 // This function is config the AD7691 ADC
14 *****/
15 void init_ad7691(void) {
16
17     // init_spi();
18     // BUSY Input Pin
19     AD7691_BUSY_PxDIR &= ~AD7691_BUSY_PIN;
20
21     // CNV Output Pin
22     AD7691_CNV_PxDIR |= AD7691_CNV_PIN;
23     AD7691_CNV_SET_LOW;
24
25     // Set BUSY as interrupt
26     AD7691_SET_IRQ_FALLING_EDGE;
27     AD7691_BUSY_IRQ_DISABLE;
28 }
```

```

1  /*****
2  **   Description:   adc12.c
3  **   Hardware:     BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date:         06/03/2013
5  **   Last Update:  26/02/2015
6  **   Author:       Nico Sassano
7  **   State        : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10 uint16_t adc12_get_volt_sample(uint8_t clk_set) {
11     uint16_t adc_value = 0;
12
13     TPS61201_DISABLE;           // TPS Enable off
14
15     if(clk_set == 16) {
16         ADC12CTL0 |= (ADC12ENC | ADC12SC); // Start conversion with sampling
17         while (!(ADC12IFG & BIT0));       // Wait while conversion is active
18         P1OUT &= ~BIT4; // OFF
19         TPS61201_ENABLE;           // TPS Enable on
20
21     } else if(clk_set == 1){
22         ADC12CTL0 |= (ADC12ENC | ADC12SC); // Start conversion with sampling
23         while (!(ADC12IFG & BIT0));       // Wait while conversion is active
24         TPS61201_ENABLE;           // TPS Enable on
25     }
26
27     TPS61201_ENABLE;           // TPS Enable on
28     adc_value = (ADC12MEM0 & 0x0FFF);    // Readout the ADC memory
29
30     //adc12_disable(); // ADC ausschalten
31
32     return adc_value;
33 }
34
35 uint16_t adc12_get_temp_sample(uint8_t clk_set) {
36     uint16_t temp_value = 0;
37
38     adc12_temp_init(clk_set);
39
40     ADC12CTL0 |= (ADC12ENC | ADC12SC); // Start conversion with sampling
41     while ((ADC12IFG & 0x0001) != 0x0001); // Wait while conversion is active
42     temp_value = (ADC12MEM0 & 0x0FFF);
43
44     //adc12_disable(); // Disable ADC again for saving energy
45     adc12_volt_init(clk_set,1);
46
47     return temp_value;
48 }
49
50 void adc12_volt_init(uint8_t clk_set, uint8_t channel) {
51     ADC12CTL0 = 0; // reset
52     ADC12CTL1 = 0; // reset
53
54     /*****
55     ** Important notice.
56     ** The hold time of the ADC have to be bigger than 23.733 us.
57     *****/
58     switch (clk_set) {
59         case 1: {
60             // Enable 2.5V shared reference, disable temperature sensor to save power
61             REFCTL0 |= REFSTR; // REF Master Control
62             REFCTL0 |= REFVSEL_2; // REF Reference Voltage Level Select 2.5V
63             REFCTL0 |= REFON; // REF Reference On
64             REFCTL0 |= REFTCOFF; // REF Temp. Sensor off
65
66             ADC12CTL0 |= ADC12REF2_5V; // Set internal REF 2.5V
67             ADC12CTL0 |= REFON; // REF Reference On
68             ADC12CTL0 |= ADC12ON; // ADC12 On
69             ADC12CTL0 |= ADC12SHT02; // 64 ADC12CLK cycles -> 64us (64 us > 23.733 us)
70
71             ADC12CTL1 = ADC12STARTADD_0; // Save conversion result to ADC12MEM0
72             ADC12CTL1 |= ADC12CONSEQ_0; // Single-channel and single-conversion
73             ADC12CTL1 = ADC12SHP; // ADC12 Sample/Hold Pulse Mode
74
75             ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1; // ADC12 Select Reference 1
76
77             if(channel == 1) {
78                 ADC12_SET_INPUT_CH1; // Select ADC channel 1
79             } else if(channel == 2) {
80                 ADC12_SET_INPUT_CH2; // Select ADC channel 2
81             }
82
83             __delay_cycles(75); // 75 us delay @ ~1MHz
84
85             ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // ADC12 Enable Conversion

```

```

86
87     }break;
88
89     case 16: {
90         // Enable 2.5V shared reference , disable temperature sensor to save power
91         REFCTL0 |= REFMASTER;           // REF Master Control
92         REFCTL0 |= REFVSEL_2;           // REF Reference Voltage Level Select 2.5V
93         REFCTL0 |= REFON;               // REF Reference On
94         REFCTL0 |= REFTCOFF;           // REF Temp. Sensor off
95
96         ADC12CTL0 = ADC12REF2_5V;       // Set internal REF 2.5V
97         ADC12CTL0 |= REFON;             // REF Reference On
98         ADC12CTL0 |= ADC12ON;          // ADC12 On
99         ADC12CTL0 |= ADC12SHT03;       // 256 ADC12CLK cycles
100        // 256 * (1/5MHz) = 51,2us (51,2 us > 23.733 us)
101
102        ADC12CTL1 = ADC12STARTADD_0;     // Save conversion result to ADC12MEM0
103        ADC12CTL1 |= ADC12CONSEQ_0;     // Single-channel and single-conversion
104        ADC12CTL1 |= ADC12SHP;         // ADC12 Sample/Hold Pulse Mode
105
106        ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1;      // ADC12 Select Reference 1
107
108        if(channel == 1) {
109            ADC12_SET_INPUT_CH1;       // Select ADC channel 1
110        }else if(channel == 2) {
111            ADC12_SET_INPUT_CH2;       // Select ADC channel 2
112        }
113
114        __delay_cycles(75);           // 75 us delay @ ~16MHz
115
116        ADC12CTL0 |= ADC12ENC;         // ADC12 Enable Conversion
117    }break;
118
119    default: break;
120 }
121 }
122
123 void adc12_temp_init(uint8_t clk_set) {
124     ADC12CTL0 = 0; // reset
125     ADC12CTL1 = 0; // reset
126
127     /******
128     ** Sampel and Hold muss bei jeder CLK Änderung neu eingestellt werden.
129     ** Die Hold-Zeit muss größer 37.56 us sein
130     *****/
131
132     ADC12CTL0 = ADC12SHT0_4 + REFON + ADC12REF2_5V + ADC12ON; // Internal ref = 1.5V
133     ADC12CTL1 |= ADC12SHP; // enable sample timer
134     ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_10; // ADC i/p ch A10 = temp sense i/p
135
136     ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
137 }
138
139 void adc12_disable(void) {
140     ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC; // Disable conversion
141     ADC12CTL0 &= ~REFON; // Disable reference voltage
142     ADC12CTL0 &= ~ADC12ON; // Disable ADC12
143 }

```



```
1  /*****
2  **   Description:   ADG918.c
3  **   Hardware:     BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date:         06/03/2013
5  **   Last Update:  26/02/2015
6  **   Author        : Nico Sassano
7  **   State         : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10 void adg918_init (void) {
11     ADG918_CTRL_PxDIR |= ADG918_CTRL_PIN ;
12 }
13
14 void adg918_wakeup (void) {
15     ADG918_CTRL_PxOUT &= ~ADG918_CTRL_PIN ;
16 }
17
18 void adg918_transceiver (void) {
19     ADG918_CTRL_PxOUT |= ADG918_CTRL_PIN ;
20 }
```

```

1  /*****
2  **   Description   : AS3930.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 10/02/2012
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author      : Phillip Durdaut, Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header\main.h"
10
11 /* Configuration Modes (bits 15-14) */
12 #define AS3930_WRITE      0x00
13 #define AS3930_READ       0x01
14 #define AS3930_COMMAND    0x03
15
16 /* Configuration Registers (bits 13-8) */
17 #define AS3930_R00        0x00
18 #define AS3930_R01        0x01
19 #define AS3930_R02        0x02
20 #define AS3930_R03        0x03
21 #define AS3930_R04        0x04
22 #define AS3930_R05        0x05
23 #define AS3930_R06        0x06
24 #define AS3930_R07        0x07
25 #define AS3930_R08        0x08
26 #define AS3930_R09        0x09
27 #define AS3930_R10        0x0a
28 #define AS3930_R11        0x0b
29 #define AS3930_R12        0x0c
30 #define AS3930_R13        0x0d
31
32 /* Commands (bits 7-0) */
33
34 #define AS3930_CLEAR_WAKE  0x00
35 #define AS3930_RESET_RSSI  0x01
36 #define AS3930_TRIM_OSC    0x02
37 #define AS3930_CLEAR_FALSE 0x03
38 #define AS3930_PRESET_DEFAULT 0x04
39
40 void as3930_spi_setup(void);
41 void as3930_spi_write_register(uint8_t address, uint8_t value);
42 char as3930_spi_read_register(uint8_t address);
43 void as3930_spi_command(uint8_t command);
44
45 void as3930_init(void) {
46     as3930_spi_setup();
47     // spi_setup(AS3930);
48
49     AS3930_WAKE_DIR_IN;
50     AS3930_WAKE_IRQ_RISING_EDGE;
51     AS3930_WAKE_IRQ_DISABLE;
52     AS3930_WAKE_CLEAR_IRQ;
53 }
54
55 void as3930_config_no_pattern(void) {
56     as3930_spi_write_register(AS3930_R01, BIT5);
57 }
58
59 void as3930_preset_default(void) {
60     as3930_spi_command(AS3930_PRESET_DEFAULT);
61 }
62
63 void as3930_clear_wakeup(void) {
64     as3930_spi_command(AS3930_CLEAR_WAKE);
65 }
66
67 uint8_t as3930_get_rssi(void) {
68     return (spi_read_register(AS3930_R10, AS3930_READ << 6) & 0x1F);
69 }
70
71 void as3930_spi_setup(void) {
72     AS3930_CS_PxDIR |= AS3930_CS_PIN; // CS is output
73     AS3930_CS_PxOUT &= ~AS3930_CS_PIN; // Chip disable
74
75     UCA0CTL1 |= UCSWRST; // Hold state machine in reset
76
77     UCA0CTL0 &= ~UCCKPH; // Data is changed on rising edge
78     UCA0CTL0 &= ~UCCKPL; // Inactive clock is low
79     UCA0CTL0 |= (UCMST | UCMSB | UCSYNC); // MSB first, Master mode, Synchronous mode
80     UCA0CTL0 &= ~(UCMODE1 | UCMODE0); // 3-pin SPI
81     UCA0MCTL = 0; // No modulation
82
83     // SMCLK / 2
84     UCA0CTL1 |= (UCSSSEL1 | UCSSSEL0);
85     UCA0BR0 = 2;

```

```
86     UCA0BR1 = 0;
87
88     // SPI functionality for pins
89     AS3930_SPI_PxSEL |= (AS3930_SPI_MOSI_PIN | AS3930_SPI_MISO_PIN | AS3930_SPI_CLK_PIN);
90     AS3930_SPI_PxDIR |= (AS3930_SPI_MOSI_PIN | AS3930_SPI_CLK_PIN); // MOSI and CLK are outputs
91     AS3930_SPI_PxDIR &= ~AS3930_SPI_MISO_PIN; // MISO is input
92
93     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // Initialize USART state machine
94 }
95
96 void as3930_spi_write_register(uint8_t address, uint8_t value) {
97     AS3930_CS_PxOUT |= AS3930_CS_PIN; // Chip enable
98     while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
99     UCA0TXBUF = address | (AS3930_WRITE << 6); // Send configuration mode and register
100    while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
101    UCA0TXBUF = value; // Send value
102    while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX complete
103    AS3930_CS_PxOUT &= ~AS3930_CS_PIN; // Chip disable
104 }
105
106 char as3930_spi_read_register(uint8_t address) {
107     uint8_t value;
108
109     AS3930_CS_PxOUT |= AS3930_CS_PIN; // Chip enable
110     while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
111     UCA0TXBUF = address | (AS3930_READ << 6); // Send configuration mode and register
112     while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
113     UCA0TXBUF = 0; // Dummy write so we can read data
114     while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX complete
115     value = UCA0RXBUF; // Read data
116     AS3930_CS_PxOUT &= ~AS3930_CS_PIN; // Chip disable
117
118     return value;
119 }
120
121 void as3930_spi_command(uint8_t command) {
122     AS3930_CS_PxOUT |= AS3930_CS_PIN; // Chip enable
123     while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
124     UCA0TXBUF = command | (AS3930_COMMAND << 6); // Send configuration mode and register
125     while (UCA0STAT & UCBSY); // Wait for TX to finish
126     AS3930_CS_PxOUT &= ~AS3930_CS_PIN; // Chip disable
127 }
```

```
1  /*****
2  **   Description   : balancing.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date         : 10/02/2012
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author       : Phillip Durdaut, Nico Sassano
7  **   State        : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10 void balancing_init (void) { // Ports initialisieren
11     BALANCE_PORT_1_PxDIR |= BALANCE_PORT_1_PIN ;
12     BALANCE_PORT_2_PxDIR |= BALANCE_PORT_2_PIN ;
13 }
14
15 void balancing_on (void) { //Balancierung an
16     BALANCE_PORT_1_PxOUT |= BALANCE_PORT_1_PIN ;
17     BALANCE_PORT_2_PxOUT |= BALANCE_PORT_2_PIN ;
18 }
19
20 void balancing_port_1_on (void) { // Pfad 1 anschalten
21     BALANCE_PORT_1_PxOUT |= BALANCE_PORT_1_PIN ;
22 }
23
24 void balancing_port_2_on (void) { // Pfad 2 anschalten
25     BALANCE_PORT_2_PxOUT |= BALANCE_PORT_2_PIN ;
26 }
27
28 void balancing_off (void) { // Balancierung ausschalten
29     BALANCE_PORT_1_PxOUT &=~BALANCE_PORT_1_PIN ;
30     BALANCE_PORT_2_PxOUT &=~BALANCE_PORT_2_PIN ;
31 }
32
33 void balancing_port_1_off (void) { // Pfad 1 ausschalten
34     BALANCE_PORT_1_PxOUT &=~BALANCE_PORT_1_PIN ;
35 }
36
37 void balancing_port_2_off (void) { // Pfad 2 ausschalten
38     BALANCE_PORT_2_PxOUT &=~BALANCE_PORT_2_PIN ;
39 }
```

```

1  /*****
2  **   Description   : CC430.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 10/12/2014
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header\main.h"
10
11 #define PATABLE_LENGTH 8
12 #define PATABLE_VAL      (0xC6)          // 0 dBm output
13 uint8_t cc430_patable[PATABLE_LENGTH] = { 0x00, 0xC6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // 10dBm output
14
15 extern volatile uint8_t brate;
16 extern volatile uint8_t irq_mode;
17 extern volatile uint8_t irq_timera;
18 extern volatile uint8_t irq_send_done_flag;
19 extern volatile uint8_t command_recived;
20
21 void cc430_tx(uint8_t packetes , uint8_t *txbuf) {
22     /*****
23     *   Sendezeit optimierung 26.03.13 NS
24     *****/
25     cc430_set_tx(brate);
26     IRQ_SET_TX;
27     CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;          // Clear the sync word detected interrupt
28     CC430_END_OF_PKT_IRQ_ENABLE;        // Enable the end of package interrupt
29
30     if(IRQ_TIMERA_IS_BALANCING) {
31         TIMER_A_STOP;
32         TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
33     }
34
35     led_on(LED_TX);
36     cc430_fill_tx_fifo(txbuf , packetes);
37     cc430_tx_start(packetes);
38
39     while(!irq_send_done_flag);
40
41     if(IRQ_TIMERA_IS_BALANCING) {
42         TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
43         TIMER_A_START_UP_MODE;
44     }
45
46     led_off(LED_TX);
47
48     irq_send_done_flag = 0;
49
50     cc430_idle();
51 }
52
53 /*****
54 **
55 *****/
56 void cc430_rx(uint8_t packages) {
57     cc430_set_rx(brate);
58     IRQ_SET_RX;
59     CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;          // Clear the sync word detected interrupt
60     CC430_END_OF_PKT_IRQ_ENABLE;        // Enable the sync word detected interrupt
61     CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;
62     cc430_rx_start(packages);           // Transceiver in RX state
63     command_recived = 0;
64 }
65
66 /*****
67 **
68 *****/
69 void tx_carrier(void) {
70     led_on(LED_TX);
71     adg918_transceiver();
72     cc430_reset();                      // Reset chip and go to idle state
73     SetVCore(2);
74
75
76
77     cc430_config_no_packet();
78     // Internal timer output (10.5 kHz) to Radio TX
79     // NOTE: SMARTF_CC430_IOCFIG0 should = 0x2E. When IOCFIG0 = 0x2D,
80     // asynchronous data into the radio is taken from GDO0 and not the timer.
81     TAICCR0 = 50;
82     TAICCR1 = 50;
83
84     TAICCTL0 = OUTMOD_4;
85     TAICCTL1 = OUTMOD_4;

```

```

86     TAICTL = TASSEL_SMCLK + MC_1 + TAICLR;
87
88     //Transmit the TX waveform asynchronously
89     cc430_tx_carrier();
90
91     while(1);
92 }
93
94 void cc430_set_tx(uint8_t brate) {
95     cc430_init_tx();
96     cc430_reset();           // Reset chip and go to idle state
97     cc430_config_packet(brate); // Configure the transceiver for sending packets
98 }
99
100 void cc430_set_rx(uint8_t brate) {
101     cc430_init_rx();
102     cc430_reset();           // Reset chip and go to idle state
103     cc430_config_packet(brate); // Configure the transceiver for sending packets
104 }
105
106 void cc430_init_rx(void) {
107     CC430_END_OF_PKT_IRQ_MODE;
108     CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE;
109     CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;
110 }
111
112 void cc430_init_burst(void) {
113
114     CC430_GDO2_IRQ_FALLING_EDGE;
115     CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
116     CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
117 }
118
119 void cc430_init_tx(void) {
120     CC430_END_OF_PKT_IRQ_MODE;
121     CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE;
122     CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;
123 }
124
125 void cc430_reset(void) {
126     Strobe (RF_SRES);           // Reset the Radio Core
127     delay_ms(5);               // Important refresh time
128 }
129
130 /*****
131 ** Konfiguration für die Burst Kalibrierung
132 *****/
133 void cc430_config_cali(void) {
134     // GDO2 Output Pin Configuration 2
135     // 0x0D -> Serial Data Output. Used for asynchronous serial mode
136     WriteSingleReg(IOCFCG2, 0x2D);
137     // GDO0 Output Pin Configuration 0
138     WriteSingleReg(IOCFCG0, 0x2E);
139     // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
140     WriteSingleReg(FIFOTHR, 0x47);
141     // Packet Automation Control 0
142     WriteSingleReg(PKTCTRL0, 0x35);
143     // Frequency Synthesizer Control 1
144     WriteSingleReg(FSCTRL1, 0x06);
145     // Frequency Control Word, High Byte
146     WriteSingleReg(FREQ2, 0x10);
147     // Frequency Control Word, Middle Byte
148     WriteSingleReg(FREQ1, 0xB1);
149     // Frequency Control Word, LOW Byte
150     WriteSingleReg(FREQ0, 0x3B);
151     /*****
152     // Modem Configuration 4
153     WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x5D);
154     // Modem Configuration 3
155     WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x3B);
156     // Modem Configuration 2
157     WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x30);
158     *****/
159     // Modem Deviation Setting
160     WriteSingleReg(DEVIATN, 0x15);
161     // Main Radio Control State Machine Configuration 1
162     WriteSingleReg(MCSM1, 0x30);
163     // Main Radio Control State Machine Configuration 0
164     WriteSingleReg(MCSM0, 0x10);
165     // Frequency Offset Compensation Configuration
166     WriteSingleReg(FOCCFG, 0x16);
167     // Wake On Radio Control
168     WriteSingleReg(WORCTRL, 0xFB);
169     // Front End RX Configuration 0
170     WriteSingleReg(FREND0, 0x11);

```

```

171 // 10 dBm output power
172 WriteBurstPatable(cc430_patable , PATABLE_LENGTH); // output power
173 //WriteSinglePatable(PATABLE_VAL);
174 }
175
176 void cc430_config_no_packet(void) {
177     WriteSingleReg(IOCFCG2,0x0B); // GDO2 Output Configuration
178     WriteSingleReg(IOCFCG0,0x2D); // GDO0 Output Configuration
179     WriteSingleReg(FIFOTHR,0x47); // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
180     WriteSingleReg(PKTCTRL0,0x32); // Packet Automation Control
181     WriteSingleReg(FSCTRL1,0x06); // Frequency Synthesizer Control
182     WriteSingleReg(FREQ2,0x10); // Frequency Control Word, High Byte
183     WriteSingleReg(FREQ1,0xB1); // Frequency Control Word, Middle Byte
184     WriteSingleReg(FREQ0,0x3B); // Frequency Control Word, Low Byte
185     WriteSingleReg(MDMCFG4,0xCA); // Modem Configuration
186     WriteSingleReg(MDMCFG3,0x93); // Modem Configuration
187     WriteSingleReg(MDMCFG2,0x30); // Modem Configuration
188     WriteSingleReg(DEVIATN,0x34); // Modem Deviation Setting
189     WriteSingleReg(MCSM0,0x10); // Main Radio Control State Machine Configuration
190     WriteSingleReg(FOCCFG,0x16); // Frequency Offset Compensation Configuration
191     WriteSingleReg(WORCTRL,0xFB); // Wake On Radio Control
192     WriteSingleReg(FREND0,0x11); // Front End TX Configuration
193     WriteSingleReg(FSCAL3,0xE9); // Frequency Synthesizer Calibration
194     WriteSingleReg(FSCAL2,0x2A); // Frequency Synthesizer Calibration
195     WriteSingleReg(FSCAL1,0x00); // Frequency Synthesizer Calibration
196     WriteSingleReg(FSCAL0,0x1F); // Frequency Synthesizer Calibration
197     WriteSinglePatable(PATABLE_VAL);
198 }
199
200 void cc430_config_no_packet_tx(void) {
201
202     WriteSingleReg(IOCFCG2, 0x02E); // 0x0D -> Serial Data Output. Used for asynchronous serial mode
203     WriteSingleReg(IOCFCG1, 0x2E); // 0x2E -> High impedance (3-state)
204     WriteSingleReg(IOCFCG0, 0x0D); // 0x36 -> CLK_XOSC/8
205     WriteSingleReg(PKTCTRL0, 0x32); // Packet Automation Control 0
206     WriteSingleReg(CHANNR,0x00);
207     WriteSingleReg(FSCTRL0, 0x06); // Frequency Synthesizer Control 1
208     WriteSingleReg(FREQ2, 0x10); // Frequency Control Word, High Byte
209     WriteSingleReg(FREQ1, 0xB1); // Frequency Control Word, Middle Byte
210     WriteSingleReg(FREQ0, 0x3B); // Frequency Control Word, LOW Byte
211
212     /******
213     // Modem Configuration 4
214     // 250kBaud -> 0xxD
215     // RX Filter 58.035714 -> 0xFx
216     WriteSingleReg(MDMCFG4, 0xFD); // org
217     // Modem Configuration 3
218     // 250kBaud -> 0x3B
219     WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x3B); // org
220
221     // Modem Configuration 2
222     // OOK -> 0x30
223     WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x30);
224     // Modem Configuration 1
225     // Channel spacing 199.951172kHz -> 0x22
226     WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
227     // Modem Configuration 0
228
229     /******
230     WriteSingleReg(DEVIATN, 0x15); // Modem Deviation Setting
231     WriteSingleReg(MCSM0, 0x18); // Main Radio Control State Machine Configuration 0
232     WriteSingleReg(FOCCFG, 0x16); // Frequency Offset Compensation Configuration
233     WriteSingleReg(FREND0, 0x11); // Front End RX Configuration 0
234
235     WriteBurstPatable(cc430_patable , PATABLE_LENGTH); // output power
236 }
237
238 void cc430_config_no_packet_rx(void) {
239
240     WriteSingleReg(IOCFCG2, 0x0D); // 0x0D -> Serial Data Output. Used for asynchronous serial mode
241     WriteSingleReg(IOCFCG1, 0x2E); // 0x2E -> High impedance (3-state)
242     WriteSingleReg(IOCFCG0, 0x36); // 0x36 -> CLK_XOSC/8
243     WriteSingleReg(FIFOTHR, 0x47); // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
244     WriteSingleReg(PKTCTRL0, 0x32); // Packet Automation Control 0
245     WriteSingleReg(FSCTRL1, 0x06); // Frequency Synthesizer Control 1
246     WriteSingleReg(FREQ2, 0x10); // Frequency Control Word, High Byte
247     WriteSingleReg(FREQ1, 0xB1); // Frequency Control Word, Middle Byte
248     WriteSingleReg(FREQ0, 0x3B); // Frequency Control Word, LOW Byte
249
250     /******
251     // Modem Configuration 4
252     // 250kBaud -> 0xxD
253     // RX Filter 58.035714 -> 0xFx
254     WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x5D); // org
255     // Modem Configuration 3

```

```

256 // 250kBaud -> 0x3B
257 WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x3B); // org
258
259 // Modem Configuration 2
260 // OOK -> 0x30
261 WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x30);
262 // Modem Configuration 1
263 // Channel spacing 199.951172kHz -> 0x22
264 WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
265 // Modem Configuration 0
266 // Channel spacing 199.951172kHz -> 0xF8
267 WriteSingleReg(MDMCFG0, 0xF8);
268 /*****/
269 WriteSingleReg(DEVIATN, 0x15); // Modem Deviation Setting
270 WriteSingleReg(MCSM2, 0x07); // Main Radio Control State Machine Configuration 2
271 WriteSingleReg(MCSM1, 0x30); // Main Radio Control State Machine Configuration 1
272 WriteSingleReg(MCSM0, 0x18); // Main Radio Control State Machine Configuration 0
273 WriteSingleReg(FOCCFG, 0x16); // Frequency Offset Compensation Configuration
274 WriteSingleReg(BSCFG, 0x6C); // Bit Synchronization Configuration
275 WriteSingleReg(AGCCTRL2, 0x03); // AGC Control 2
276 WriteSingleReg(AGCCTRL1, 0x40); // AGC Control 1
277 WriteSingleReg(AGCTRL0, 0x91); // AGC Control 0
278 WriteSingleReg(WORCTRL, 0x8F); // Wake On Radio Control
279 WriteSingleReg(FREND1, 0x56); // Front End RX Configuration 1
280 WriteSingleReg(FREND0, 0x11); // Front End RX Configuration 0
281 WriteBurstPatable(cc430_patable, PATABLE_LENGTH); // output power
282 }
283
284 void cc430_config_cali_burst(void) {
285
286 WriteSingleReg(IOCFG2, 0x0D); // 0x0D -> Serial Data Output. Used for asynchronous serial mode
287 WriteSingleReg(IOCFG1, 0x2E); // 0x2E -> High impedance (3-state)
288 WriteSingleReg(IOCFG0, 0x2D); // 0x36 -> CLK_XOSC/8
289 WriteSingleReg(FIFOTHR, 0x47); // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
290 WriteSingleReg(PKTCTRL0, 0x32); // Packet Automation Control 0
291 WriteSingleReg(FSCTRL1, 0x06); // Frequency Synthesizer Control 1
292 WriteSingleReg(FREQ2, 0x10); // Frequency Control Word, High Byte
293 WriteSingleReg(FREQ1, 0xB1); // Frequency Control Word, Middle Byte
294 WriteSingleReg(FREQ0, 0x3B); // Frequency Control Word, LOW Byte
295
296 /*****/
297 // Modem Configuration 4
298 // 250kBaud -> 0xxD
299 // RX Filter 58.035714 -> 0xFx
300 WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x5D); // org
301 // Modem Configuration 3
302 // 250kBaud -> 0x3B
303 WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x3B); // org
304 // Modem Configuration 2
305 // OOK -> 0x30
306 WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x30);
307 // Modem Configuration 1
308 // Channel spacing 199.951172kHz -> 0x22
309 WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
310 // Modem Configuration 0
311 // Channel spacing 199.951172kHz -> 0xF8
312 WriteSingleReg(MDMCFG0, 0xF8);
313 /*****/
314 WriteSingleReg(DEVIATN, 0x15); // Modem Deviation Setting
315 WriteSingleReg(MCSM2, 0x07); // Main Radio Control State Machine Configuration 2
316 WriteSingleReg(MCSM1, 0x30); // Main Radio Control State Machine Configuration 1
317 WriteSingleReg(MCSM0, 0x18); // Main Radio Control State Machine Configuration 0
318 WriteSingleReg(FOCCFG, 0x16); // Frequency Offset Compensation Configuration
319 WriteSingleReg(BSCFG, 0x6C); // Bit Synchronization Configuration
320 WriteSingleReg(AGCCTRL2, 0x03); // AGC Control 2
321 WriteSingleReg(AGCCTRL1, 0x40); // AGC Control 1
322 WriteSingleReg(AGCTRL0, 0x91); // AGC Control 0
323 WriteSingleReg(WORCTRL, 0x8F); // Wake On Radio Control
324 WriteSingleReg(FREND1, 0x56); // Front End RX Configuration 1
325 WriteSingleReg(FREND0, 0x11); // Front End RX Configuration 0
326
327 // WriteBurstPatable(cc430_patable, PATABLE_LENGTH); // output power
328 WriteSinglePatable(PATABLE_VAL);
329 }
330
331 void cc430_config_packet(uint8_t brate) {
332 WriteSingleReg(IOCFG0, 0x06); //GDO0 Output Configuration
333 WriteSingleReg(IOCFG2, 0x29); //GDO0 Output Configuration
334 WriteSingleReg(FIFOTHR, 0x47); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
335 WriteSingleReg(SYNCL, 0x81); // Sync-Word Hi-byte
336 WriteSingleReg(SYNCO, 0x81); // Sync-Word Lo-byte
337 WriteSingleReg(PKTCTRL0, 0x04); // Flush RX packets when CRC is not OK, Address check and 0x00 broadcast.
338 WriteSingleReg(PKTCTRL1, 0x0A); // // No whitening, FIFO mode, CRC enabled, Fixed packet length
339 WriteSingleReg(ADDR, ADDRESS_THIS_SENSOR); // // Adress of this Sensor
340 WriteSingleReg(FSCTRL1, 0x06); // IF frequency: 152.34375 kHz

```



```

341 WriteSingleReg(FREQ2,0x10); // Carrier frequency: 433.999969 MHz
342 WriteSingleReg(FREQ1,0xB1); //
343 WriteSingleReg(FREQ0,0x3B); //
344
345 WriteSingleReg(AGCCTRL2, 0x05);
346 WriteSingleReg(AGCCTRL1, 0x00);
347 WriteSingleReg(AGCCTRL0, 0x91);
348 switch(brate) {
349     /******
350     ** Übertragungstest
351     ** 40 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
352     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
353     *****/
354     case 40: {
355         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8A);
356         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x93);
357         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
358         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
359         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);
360     }break;
361
362     /******
363     ** Übertragungstest
364     ** 59.906 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
365     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
366     *****/
367     case 60: {
368         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8B);
369         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x2E);
370         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
371         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
372         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);
373     }break;
374
375     /******
376     ** Übertragungstest
377     ** 79.9408 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
378     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
379     *****/
380     case 80: {
381         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8B);
382         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x93);
383         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
384         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
385         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);
386     }break;
387
388     /******
389     ** Übertragungstest
390     ** 99.9756 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 203.125000 kHz
391     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
392     *****/
393     case 100: {
394         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8B);
395         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0xF8);
396         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
397         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
398         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);
399     }break;
400
401     /******
402     ** Übertragungstest
403     ** 119.812 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
404     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
405     *****/
406     case 120: {
407         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8C);
408         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x2E);
409         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
410         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
411         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);
412     }break;
413
414     /******
415     ** Übertragungstest
416     ** 140.045 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
417     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
418     *****/
419     case 140: {
420         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8C);
421         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x61);
422         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
423         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
424         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);

```

```

425     }break;
426
427     /*****
428     ** Übertragungstest
429     ** 159.882 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
430     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
431     *****/
432     case 160: {
433         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8C);
434         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0x93);
435         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
436         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
437         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);
438     }break;
439
440     /*****
441     ** Übertragungstest
442     ** 180.115 kBaud, OOK, Channel spacing: 149.963379 kHz, RX filter bandwidth: 406.250000 kHz
443     ** No Manchester en/decoding, 30/32 SYNC bits detected, No FEC, 4 Preamble bytes
444     *****/
445     case 180: {
446         WriteSingleReg(MDMCFG4, 0x8C);
447         WriteSingleReg(MDMCFG3, 0xC6);
448         WriteSingleReg(MDMCFG2, 0x33);
449         WriteSingleReg(MDMCFG1, 0x22);
450         WriteSingleReg(MDMCFG0, 0x7A);
451     }break;
452
453     }
454     WriteSingleReg(DEVIATN,0x15); //Modem Deviation Setting
455     WriteSingleReg(MCSM0,0x10); // Calibrate when going from IDLE to RX or TX, Crystal off when in SLEEP state
456     WriteSingleReg(FOCCFG,0x16); // FCL gain: 3000, Saturation point for the frequency offset compensation algorithm ->
457     SmartRF Studio
458
459     WriteBurstPatable(cc430_patable, PATABLE_LENGTH);
460
461     WriteSingleReg(FREND0,0x11); //Front End TX Configuration
462     WriteSingleReg(FSCAL3,0xEA); //Frequency Synthesizer Calibration
463     WriteSingleReg(FSCAL2,0x2A); //Frequency Synthesizer Calibration
464     WriteSingleReg(FSCAL1,0x00); //Frequency Synthesizer Calibration
465     WriteSingleReg(FSCAL0,0x1F); //Frequency Synthesizer Calibration
466 }
467 void cc430_fill_tx_fifo(uint8_t * buffer, uint8_t length) {
468     // Clear TX FIFO
469     cc430_clear_tx_fifo();
470
471     // Transfer the bytes to the TX fifo of the transceiver
472     WriteBurstReg(RF_TXFIFOWR, buffer, length);
473 }
474
475 void cc430_read_rx_fifo(uint8_t * buffer, uint8_t length) {
476     // Disable the receiver
477     cc430_idle();
478     // Transfer the bytes via SPI from the RX fifo
479     ReadBurstReg(RF_RXFIFORD, buffer, length);
480 }
481 void cc430_enable_crc(void) {
482     uint8_t current_state;
483     current_state = ReadSingleReg(PKTCTRL1);
484     WriteSingleReg(PKTCTRL1, current_state | CC430_CRC_EN );
485 }
486
487 void cc430_disable_crc(void) {
488     uint8_t current_state;
489     current_state = ReadSingleReg(PKTCTRL1);
490     WriteSingleReg(PKTCTRL1, current_state & ~CC430_CRC_EN );
491 }
492 void cc430_clear_tx_fifo(void) {
493     Strobe(RF_SIDLE); // Needs to be in Idle state to Flush Fifo
494     Strobe(RF_SFTX); // Strobe SFTX -> Flush TX-Fifo
495 }
496
497 void cc430_clear_rx_fifo(void) {
498     Strobe(RF_SIDLE); // Needs to be in Idle state to Flush Fifo
499     Strobe(RF_SFRX); // Strobe SFTX -> Flush RX-Fifo
500 }
501
502 uint8_t cc430_get_rxbytes(void) {
503     return (ReadSingleReg(RXBYTES));
504 }
505
506 void cc430_sleep(void) {
507     Strobe(RF_SPWD);
508 }

```

```
509
510 void cc430_idle(void) {
511     Strobe(RF_SIDLE);
512 }
513
514 void cc430_tx_carrier(void) {
515     Strobe(RF_SIDLE);
516     Strobe(RF_STX);
517 }
518 void cc430_tx_start(uint8_t packages_to_tx) {
519     // DATA packet length
520     WriteSingleReg(PKTLEN, packages_to_tx);
521
522     // Enable CRC calculation when transmitting data
523     cc430_enable_crc();
524
525     // TX state
526     Strobe(RF_STX);
527
528     // Wait 10 ms for TX finished
529     //delay_ms(8);
530 }
531
532 void cc430_rx_start(uint8_t packages_to_rx) {
533     // DATA packet length
534     WriteSingleReg(PKTLEN, packages_to_rx);
535
536     // Enable CRC check when receiving data
537     cc430_enable_crc();
538
539     // Clear RX FIFO
540     cc430_clear_rx_fifo();
541
542     // RX state
543     Strobe(RF_SRX);
544 }
545
546 void cc430_burst_rx(void) {
547     //Strobe(RF_SIDLE);
548     Strobe(RF_SRX);
549 }
550
551 void cc430_burst_tx(void) {
552     // TX state
553     Strobe(RF_STX);
554 }
555
556 uint8_t cc430_get_partnum(void) {
557     return ReadSingleReg(PARINUM);
558 }
559
560 uint8_t cc430_get_version(void) {
561     return ReadSingleReg(VERSION);
562 }
563
564 uint8_t cc430_get_marcstate(void) {
565     return ReadSingleReg(MARCSTATE);
566 }
```



```
86                                     // (374 + 1) * 32768 = 12MHz
87                                     // Set FLL Div = fDCOCLK/2
88     __bic_SR_register(SCG0);          // Enable the FLL control loop
89
90     // Worst-case settling time for the DCO when the DCO range bits have been
91     // changed is  $n \times 32 \times 32 \times f_{MCLK} / f_{FLL\_reference}$ . See UCS chapter in 5xx
92     // UG for optimization.
93     //  $32 \times 32 \times 12 \text{ MHz} / 32,768 \text{ Hz} = 375000 = \text{MCLK cycles for DCO to settle}$ 
94     __delay_cycles(375000);
95 }break;
96
97 case 16: {
98     clk_set = 16;    //CLK ist auf 16MHz gesetzt
99
100
101     __bis_SR_register(SCG0);          // Disable the FLL control loop
102     UCSCCTL0 = 0x0000;                // Set lowest possible DCOx, MODx
103     UCSCCTL1 = DCORSEL_7;             // Select DCO range 24MHz operation
104     UCSCCTL2 = FLLD_1 + dco_value;    // Set DCO Multiplier for 12MHz
105                                         //  $(N + 1) * FLLRef = Fdco$ 
106                                         //  $(487 + 1) * 32768 = 16\text{MHz}$ 
107     __bis_SR_register(SCG0);          // Set FLL Div = fDCOCLK/2
108                                         // Enable the FLL control loop
109
110     // Worst-case settling time for the DCO when the DCO range bits have been
111     // changed is  $n \times 32 \times 32 \times f_{MCLK} / f_{FLL\_reference}$ . See UCS chapter in 5xx
112     // UG for optimization.
113     //  $32 \times 32 \times 12 \text{ MHz} / 32,768 \text{ Hz} = 375000 = \text{MCLK cycles for DCO to settle}$ 
114     __delay_cycles(500000);
115 }break;
116 }
117 }
118 }
```

```
1  /*****
2  **   Description   : delay.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 09/04/2013
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author       : Nico Sassano
7  **   State        : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10 extern uint8_t clk_set;
11 void delay(u16_t i);
12
13 void delay_10us_16MHz(u16_t delay_10us_16MHz) {
14     while (delay_10us_16MHz > 0) {
15         delay(DELAY_CYCLES_PER_10US_16MHZ);
16         delay_10us_16MHz--;
17     }
18 }
19
20 void delay(u16_t i) {
21     while (i > 0) {
22         _NOP();
23         i--;
24     }
25 }
```

```

1  /*****
2  **   Description   : i2c.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 05/03/2013
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10 #define UCB0BR_BIT_CLK 100.0 // UCB0 Bit Clock [kHz]
11 // UCB0 Baud Rate Control 0 Setting
12 void i2c_init(void) {
13     I2C_SDA_PxSEL |= I2C_SDA_PIN; //Set I2C Pins to I2C Communication
14     I2C_SCL_PxSEL |= I2C_SCL_PIN;
15
16
17     UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Reset the USCI logic
18
19
20     /** control register 0 *****/
21     * Set UCB0CTL1 -> Master mode | I2C Mode | Synchronous mode
22     * -> Own address is a 7-bit address, Address slave
23     * with 7-bit address
24     *****/
25     UCB0CTL0 = (UCMST | UCMODE1 | UCMODE0 | UCSYNC);
26
27     /** control register 1 *****/
28     * Set UCB0CTL1 -> clock source SMCLK | Software reset enable
29     * -> Receiver | Acknowledge normally | No STOP generated |
30     * Do not generate START condition
31     *****/
32     UCB0CTL1 = (UCSSEL1 | UCSWRST);
33
34
35     /** bit rate control register 0/1 *****/
36     * -> Datasheet S. 476 <-
37     * Baud rate = 100kbps
38     * -> f_brclk = SMCLK = 0.5MHz
39     * -> UCBRX = 5
40     * f_bitclk = f_brclk / UCBRX = 100kHz,
41     *****/
42     //UCB0BR0 = ((uint16_t) SMCLK / UCB0BR_BIT_CLK); // low byte, UCB0RX = (UCB0R0 + UCB0R1 x 128)
43     UCB0BR0 = 0x0A;
44     UCB0BR1 = 0x00; // high byte
45
46     /** Own Address Register *****/
47     * I2C own 7-bit address = 0x7B (123)
48     *****/
49     UCB0I2COA |= 0x007B;
50
51     /** Interrupt Enable Register *****/
52     * Interrupt disabled for Not-acknowledge, Start/Stop condition and
53     * Arbitration lost
54     *****/
55     UCB0I2CIE = 0x00;
56 }
57
58 void i2c_write(uint8_t slave_address, uint8_t data_length, uint8_t *data) {
59     uint8_t i;
60
61     UCB0CTL1 |= UCTR; // set transmitter-mode
62     UCB0I2CSA = slave_address; // set slave address
63     UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // unset SWRESET
64     UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // send START-CON
65     UCB0TXBUF = data[0]; // then write data
66
67     for(i = 1; i < data_length; i++) {
68         while(1) { // wait until ...
69             /*if((UCB0STAT & UCNACKIFG) == UCNACKIFG) // NACK from slave
70             {
71                 UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // then send STOP-CON
72                 UCB0STAT &= ~UCNACKIFG; // reset flag
73                 UCB0CTL1 |= UCSWRST; // set SWRESET
74                 break;
75             }*/
76
77             if((IFG2 & UCB0TXIFG) == UCB0TXIFG) // data / start-con was send
78             {
79                 UCB0TXBUF = data[i]; // then write data
80                 break;
81             }
82         }
83     }
84
85     while((IFG2 & UCB0TXIFG) != UCB0TXIFG); // wait until data/start-con was send

```

```
86
87     UCB0CTL1 |= UCTXSTP;           // send STOP-COND
88     while((UCB0CTL1 & UCTXSTP) == UCTXSTP); // wait until STOP-con was send
89
90     UCB0CTL1 |= UCSWRST;           // set SWRESET
91 }
92
93 void i2c_read(uint8_t slave_address, uint8_t data_length, uint8_t *data) {
94     uint8_t i;
95
96     UCB0CTL1 &= ~UCTR;             // reset transmitter-mode
97     UCB0I2CSA = slave_address;    // set slave address of sensor
98     UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;         // unset SWRESET
99     UCB0CTL1 |= UCTXSTT;          // send START-CON
100
101     if(data_length > 1)
102     {
103         for(i = 0; i < data_length; i++)
104         {
105             while(1)
106             {
107                 /******
108                 * IFG2 = Interrupt Flag Register 2
109                 *****/
110                 if((IFG2 & UCB0RXIFG) == UCB0RXIFG) // data / start-con was send
111                 {
112                     data[i] = UCB0RXBUF;           // readout data
113                     if(i == data_length-2)        // if next byte will be the last one
114                         UCB0CTL1 |= UCTXSTP;     // send STOP-CON after next receive
115
116                     break;
117                 }
118             }
119         }
120     }
121     else
122     {
123         while((UCB0CTL1 & UCTXSTT) == UCTXSTT); // wait for acknowledge of slave,
124         UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // then send STOP-COND immediately
125
126         data[0] = UCB0RXBUF; // readout data
127     }
128
129     while((UCB0CTL1 & UCTXSTP) == UCTXSTP); // wait until STOP-con was send
130     UCB0CTL1 |= UCSWRST; // set SWRESET
131 }
```



```

1  /*****
2  **   Description   :  init.c
3  **   Hardware     :  BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        :  09/04/2013
5  **   Last Update  :  02/08/2015
6  **   Author      :  Nico Sassano
7  **   State       :  Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10
11 extern volatile uint8_t brate_start;
12 extern volatile uint8_t brate;
13 extern volatile uint16_t upper_alarm_temp;
14 extern volatile uint16_t lower_alarm_temp;
15 extern volatile uint16_t sample_burst_buf[BURST_VALUES];
16 extern volatile uint8_t irq_alert;      // TMP102 Alarm
17
18 void init(void) {
19
20     TPS61201_PxDIR |= TPS61201_PIN;
21     TPS61201_ENABLE;
22
23     _EINT();    //global interrupts enable
24
25     // LEDs initialisieren
26     led_init();
27     i2c_init();
28     brate = brate_start;
29
30     // RF-switch
31     adg918_init();
32     adg918_wakeup();    // Connect the loop antenna with the wakeup circuit
33     adg918_transceiver();    // Connect the loop antenna with the wakeup circuit
34
35     // Balancing unit
36     balancing_init();
37     balancing_off();    // Balancing unit off
38
39     /*****
40     ** Timer konfigurieren
41     *****/
42     cc430_reset();
43     cc430_sleep();    // Power down state
44
45     // Configure packet received interrupt
46     CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;
47     CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE;
48
49     // LF wakeup receiver
50     as3930_init();
51     as3930_preset_default();    // Reset
52     as3930_config_no_pattern();    // Wakeup upon LF carrier detection
53     as3930_clear_wakeup();    // Clear wakeup
54
55     // Alles LED leuchten 3 Sekunden beim start
56     led_on(LED_ALL);
57     delay_ms(300);
58     led_off(LED_ALL);
59 }
60
61 void init_for_sleep(void) {
62
63     // RF-switch
64     adg918_init();
65     adg918_wakeup();    // Connect the loop antenna with the wakeup circuit
66
67     balancing_off();    // Balancing unit off
68
69     // CC1101 transceiver
70     // cc430_init();
71     cc430_reset();
72     cc430_sleep();    // Power down state
73
74     // Configure packet received interrupt
75     CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;
76     CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE;
77
78     // LF wakeup receiver
79     as3930_init();
80     as3930_preset_default();    // Reset
81     as3930_config_no_pattern();    // Wakeup upon LF carrier detection
82     as3930_clear_wakeup();    // Clear wakeup
83
84     // Configure Wake interrupt
85     AS3930_WAKE_CLEAR_IRQ;

```

```
86     AS3930_WAKE_IRQ_ENABLE;
87
88     // Global interrupt enable
89
90     _EINT();
91 }
```

```

1  /*****
2  **   Description   : isr.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 09/04/2013
5  **   Last Update : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10
11 extern volatile uint8_t wakeup_state;
12 extern volatile state_t state;
13 /*****
14 ** CLK
15 *****/
16 extern volatile uint8_t clk_set;
17
18 /*****
19 ** RX
20 *****/
21 extern volatile uint8_t rx_command;
22 extern volatile uint8_t rx_data_length;
23
24 /*****
25 ** Balancing
26 *****/
27 extern volatile uint16_t balancing_value; // Zielwert der Balancierung
28 extern volatile uint16_t balancing_time;
29 extern volatile uint8_t balanc_state;
30 extern volatile uint8_t temp_state;
31 extern volatile uint16_t upper_balanc_temp;
32 extern volatile uint16_t lower_balanc_temp;
33 extern volatile uint16_t upper_alarm_temp;
34 extern volatile uint16_t lower_alarm_temp;
35
36 /*****
37 ** Data buffer
38 *****/
39 uint16_t config_value;
40 extern volatile uint16_t sample_burst_buf[BURST_VALUES];
41 extern volatile uint16_t sample_buf_volt; // The latest cell voltage sample
42 //extern volatile uint16_t sample_buf_temp;
43
44 /*****
45 ** Kalibrierung
46 *****/
47 extern volatile uint8_t cali_pos_offset_tmp102;
48 extern volatile uint8_t cali_neg_offset_tmp102;
49 extern volatile uint8_t cali_pos_offset_msp430;
50 extern volatile uint8_t cali_neg_offset_msp430;
51 extern volatile uint8_t cali_pos_offset_adc;
52 extern volatile uint8_t cali_neg_offset_adc;
53 extern volatile uint32_t clk_cali_counter; // Counter for the clock calibration
54
55 /*****
56 ** Burst Mode
57 *****/
58 extern volatile uint8_t burst_freq; // Burst Frequenz
59 extern volatile uint16_t burst_values; // Anzahl der erwarteten Burst Werte
60 extern volatile uint16_t burst_counter; // Counter der Burst-Werte
61 extern volatile uint16_t burst_memory; // Counter der Burst-Speichers
62 extern volatile uint8_t frame_number;
63 extern volatile uint8_t burst_frame_length; // 50 -> 25 Werten
64 extern volatile uint8_t burst_error;
65 extern volatile uint8_t burst_error_flag;
66
67 /*****
68 ** ADC Select
69 *****/
70 extern volatile uint8_t adc_mode;
71
72 /*****
73 ** Goertzel
74 *****/
75 extern volatile float Fs_goertzel; // Burstfrequency
76 extern volatile float f_goertzel; // Signal frequency
77 extern volatile float m;
78
79 /*****
80 ** AD5270
81 *****/
82 extern volatile uint16_t ad5270_1_value;
83 extern volatile uint16_t ad5270_2_value;
84
85 /*****

```

```

86  ** Interruptflags
87  *****/
88  extern volatile uint8_t irq_mode;           // PORT1 IRQ Status
89  extern volatile uint8_t irq_send_done_flag; // CC1101 senden
90  extern volatile uint8_t irq_alert;         // TMP102 Alarm
91  extern volatile uint8_t irq_timera;       // Status TimerA
92  extern volatile uint8_t irq_timerb;       // Status TimerB
93
94
95  /*****
96  ** Communication states
97  *****/
98  extern volatile uint8_t command_recived;
99  extern volatile uint8_t wakeup_state;
100 extern volatile uint8_t brate_start;
101 extern volatile uint8_t brate;
102
103 extern volatile uint16_t delay_counter;
104
105 extern volatile uint8_t gdo0_state;
106 extern volatile uint8_t burst_cal_flag;
107
108 volatile uint32_t CC430_GDO0_OUT_PMAP = 0;
109
110 /*****
111 // AD7691 Test mode
112 // Data declaration for thesting AD7691
113 // This can be deleted after testing the ADC
114 /*****
115 //extern volatile uint8_t AD7691_index;
116 //extern volatile uint8_t AD7691_count;
117 //extern volatile uint32_t AD7691_data[2]; // 24-bit data storage
118 //extern volatile uint32_t AD7691_asynch_counter;
119 //extern volatile uint32_t AD7691_values;
120 //extern volatile uint32_t AD7691_frequency_time;
121 //extern volatile uint32_t AD7691_value;
122 extern volatile uint32_t AD7691_value_storage[1];
123
124
125 uint16_t index = 0;
126
127 #pragma vector=WDT_VECTOR
128 __interrupt void wdttimer(void)
129 {
130
131 }
132
133 /*****
134 ** CC1101 Radio Core Interrupts
135 ** See CC430F5137 CC430 Family User's Guide (Rev. E) -> slau259e.pdf table 25-5 on page 675
136 *****/
137 #pragma vector=CC1101_VECTOR
138 __interrupt void CC1101_ISR(void) {
139     switch(__even_in_range(RF1AIV,32)) { // Prioritizing Radio Core Interrupt
140
141
142         case RF1AIV_NONE: break;
143         /*****
144         * Case 2: RFIFG0 Based on GDO0 signal
145         * programmable using IOCFG0 (0x02) register of radio core.
146         *****/
147         case RF1AIV_RFIFG0: break;
148
149         /*****
150         * Case 4: RFIFG1 Based on GDO1 signal
151         * programmable using IOCFG1 (0x01) register of radio core.
152         *****/
153         case RF1AIV_RFIFG1: break;
154
155         /*****
156         * Case 6: RFIFG2 Based on GDO2 signal
157         * programmable using IOCFG2 (0x00) register of radio core.
158         *****/
159         case RF1AIV_RFIFG2:
160
161             /*****
162             ** IRQ Burstmode
163             *****/
164             // Interrupt disable
165             CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
166             CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
167
168             TIMER_B_STOP; // Timer stoppen
169             P1OUT &= ~BIT4; // OFF
170             if (IRQ_IS_CALL_BURST) {

```

```

171         AD7691_CNVS_SET_HIGH;
172         TA0CTL |= MC_1;
173         BURST_CALL_FLAG_SET;
174     } else if (IRQ_IS_BURST) {
175
176         if (ADC12_INT_IS_SELECT) {
177             // For 12 Bit ADC BEGIN *****
178
179             uint16_t adc_voltage = adc12_get_volt_sample (clk_set);
180             // sample_burst_buf[burst_counter] = adc_voltage;
181
182             uint8_t mod = burst_counter % 4;
183
184             // Hier werden die ADC-Werte Codiert, bzw. die Bits geschoben
185             if (mod == 0){
186                 sample_burst_buf[burst_memory] = ((adc_voltage & 0x0FFF) << 4) & 0xFF0;
187
188             } else if (mod == 1){
189                 sample_burst_buf[burst_memory] |= ((adc_voltage & 0x0F00) >> 8) & 0x00FF;
190                 burst_memory++;
191
192                 sample_burst_buf[burst_memory] = ((adc_voltage & 0x00FF) << 8) & 0xFF0;
193
194             } else if (mod == 2){
195                 sample_burst_buf[burst_memory] |= ((adc_voltage & 0x0FF0) >> 4) & 0x00FF;
196                 burst_memory++;
197
198                 sample_burst_buf[burst_memory] = ((adc_voltage & 0x000F) << 12) & 0xF00;
199
200             } else if (mod == 3){
201                 sample_burst_buf[burst_memory] |= ((adc_voltage & 0x0FFF) << 0) & 0x0FFF;
202                 burst_memory++;
203             }
204
205             P1OUT |= BIT4; // On
206             burst_counter++; // Burstwert hochzählen
207             // For 12 Bit ADC END *****
208
209         } else if (AD7691_EXT_IS_SELECT) {
210             //*** For testing AD7691 BEGIN
211             *****
212
213             AD7691_CNVS_SET_HIGH; // start a new conversion
214
215             AD7691_SET_IRQ_FALLING_EDGE;
216             AD7691_BUSY_CLEAR_IRQ;
217             AD7691_BUSY_IRQ_ENABLE;
218
219             AD7691_CNVS_SET_LOW;
220             // Now waiting for a AD7691 Interrupt
221             //*** For testing AD7691 END
222             *****
223         }
224
225         if (burst_freq >= BURST_FREQ_2000HZ) {
226             CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
227             if (burst_counter < burst_values)
228                 CC430_GDO2_IRQ_ENABLE;
229             // Flag zurücksetzen
230             TIMER_B_FLAG_RESET;
231
232             // Timer einstellen
233             timer_b_init_burst (burst_freq);
234
235             // Timer starten
236             TIMER_B_START_UP_MODE;
237         }
238
239         break;
240
241         /*****
242         * Case 8: RFIFG3
243         * Positive edge: RX FIFO filled or above the RX FIFO threshold.
244         * Negative edge: RX FIFO drained below RX FIFO threshold.
245         * This is equal to GDOx_CFG=0 on the CC1101 module
246         *****/
247         case RF1AIV_RFIFG3: break;
248
249         /*****
250         * Case 10: RFIFG4
251         * Positive edge: RX FIFO filled or above the RX FIFO threshold or end of packet is reached.
252         * Negative edge: RX FIFO empty.
253         * This is equal to GDOx_CFG=1 on the CC1101 module
254         *****/

```

```

254     case RF1AIV_RFIFG4: break;
255
256     /******
257     * Case 12: RFIFG5
258     * Positive edge: TX FIFO filled or above the TX FIFO threshold.
259     * Negative edge: TX FIFO below TX FIFO threshold.
260     * This is equal to GDOx_CFG=2 on the CC1101 module
261     *****/
262     case RF1AIV_RFIFG5: break;
263
264     /******
265     * Case 14: RFIFG6
266     * Positive edge: TX FIFO full.
267     * Negative edge: TX FIFO below TX FIFO threshold.
268     * This is equal to GDOx_CFG=3 on the CC1101 module
269     *****/
270     case RF1AIV_RFIFG6: break;
271
272     /******
273     * Case 16: RFIFG7
274     * Positive edge: RX FIFO overflowed.
275     * Negative edge: RX FIFO flushed.
276     * This is equal to GDOx_CFG=4 on the CC1101 module
277     *****/
278     case RF1AIV_RFIFG7: break;
279
280     /******
281     * Case 18: RFIFG8
282     * Positive edge: TX FIFO underflowed.
283     * Negative edge: TX FIFO flushed.
284     * This is equal to GDOx_CFG=5 on the CC1101 module
285     *****/
286     case RF1AIV_RFIFG8: break;
287
288     /******
289     * Case 20: RFIFG9
290     * Positive edge: Sync word sent or received.
291     * Negative edge: End of packet or in RX when optional address check
292     * fails or RX FIFO overflows or in TX when TX FIFO underflows.
293     * This is equal to GDOx_CFG=6 on the CC1101 module
294     *****/
295     case RF1AIV_RFIFG9: // End of Packet IRQ Received
296
297         if (IRQ_IS_RX) {
298             /******
299             ** IRQ Packet empfangen
300             *****/
301             //TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
302             _DINT(); // Globale Interrupts ausschalten
303
304             volatile uint8_t bytes_in_fifo = 0;
305             CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE;
306             // CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ; // Seems to Auto-Clear on Read from RX-Fifo TODO : verifizieren
307
308             rx_command = COMMAND_DOWNLINK_UNKOWN;
309             command_received = 1;
310             bytes_in_fifo = cc430_get_rxbytes();
311             if (bytes_in_fifo >= 2)
312                 bytes_in_fifo -= 2; //Non-Zero Values from get_rxbytes are to great by 2 TODO Ursache ermitteln
313
314             uint8_t rxbuf[64];
315             // Check whether received data is valid
316             if ((bytes_in_fifo == HEADER_LENGTH + rx_data_length)) {
317
318                 cc430_read_rx_fifo(rxbuf, HEADER_LENGTH + rx_data_length);
319                 rx_data_length = 0; // Datenlänge wieder zurücksetzen
320
321                 if (rxbuf[0] == BROADCAST || rxbuf[0] == ADDRESS_THIS_SENSOR) { // TODO Adresse müsste automatisch geprüft
322                     werden.
323
324                     led_on(LED_RX); // Empfangs LED an
325
326                     rx_command = rxbuf[1]; // Empfangenes Kommando
327
328                     switch (rx_command) {
329                         /******
330                         ** Dekodierung des WAKEUP Kommandos
331                         ** Paketzusammenstellung:
332                         ** ( Adr. ZS | Kommando | 0x00 | 0x00 )
333                         *****/
334                         case COMMAND_WAKEUP: {
335                             state = S_WAKEUP_RX;
336                             wakeup_state = 1;
337                             }break;

```

```

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

/*****
** Dekodierung des WAKEUP_DONE Kommandos
** Paketzusammenstellung:
** ( Adr. ZS | Kommando | 0x00 | 0x00 )
*****/
case COMMAND_WAKEUP_DONE: {
    state = S_WAKEUP_DONE;
    if (!wakeup_state)
        rx_command = COMMAND_DOWNLINK_SLEEP;

}break;

/*****
** Dekodierung des AD5270_1 Kommandos
** Paketzusammenstellung:
** ( Adr. ZS | Kommando | value 1 | value 2 )
*****/
case COMMAND_AD5270_1: {
    ad5270_1_value = rxbuf[2];
    ad5270_2_value = rxbuf[3];
}break;

/*****
** Dekodierung des AD5270_2 Kommandos
** Paketzusammenstellung:
** ( Adr. ZS | Kommando | value 1 | value 2 )
*****/
case COMMAND_AD5270_2: {
    ad5270_1_value = rxbuf[2];
    ad5270_2_value = rxbuf[3];
}break;

/*****
** Dekodierung des CONFIG_SET Kommandos
** Paketzusammenstellung:
** ( Adr. ZS | Kommando | Anzahl | 0x00 )
*****/
case COMMAND_DOWNLINK_CONFIG_SET: {
    rx_data_length = rxbuf[2]; // Länge der nächsten Datensendung

}break;

/*****
** Dekodierung des CONFIG Kommandos
** Paketzusammenstellung:
**      0      1      2      3
** ( Adr. ZS | Kommando | 0x00 | 0x00 )
**      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
**      10
** ( Brate | oberer Bal. Wert | unterer Bal. Wert | oberer Alarmwert | unterer Alarmwert | Burst
**   Framelänge | ADC Auswahl)
*****/
case COMMAND_DOWNLINK_CONFIG: {
    rx_data_length = 0; // Datenlänge zurücksetzen
    uint16_t msb = 0;
    uint16_t lsb = 0;

    // Übertragungsrate
    brate = rxbuf[HEADER_LENGTH + 0];

    // oberer Balancierungswert
    msb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 1] & 0x0F)) << 8) & 0xFF00;
    lsb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 2] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
    upper_balanc_temp = msb | lsb;
    msb = 0;
    lsb = 0;

    // unterer Balancierungswert
    msb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 3] & 0x0F)) << 8) & 0xFF00;
    lsb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 4] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
    lower_balanc_temp = msb | lsb;
    msb = 0;
    lsb = 0;

    // oberer Alarmwert
    msb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 5] & 0x0F)) << 8) & 0xFF00;
    lsb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 6] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
    upper_alarm_temp = msb | lsb;
    msb = 0;
    lsb = 0;

    // unterer Alarmwert
    msb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 7] & 0x0F)) << 8) & 0xFF00;
    lsb = (((uint16_t)(rxbuf[HEADER_LENGTH + 8] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
    lower_alarm_temp = msb | lsb;

```

```
421
422 // Burst Framelänge
423 burst_frame_lenght = rxbuf[HEADER_LENGTH + 9];
424
425
426 }break;
427
428 /******
429 ** Dekodierung des Balancierungsheader
430 ** Paketzusammenstellung:
431 ** ( Adr. ZS | Kommando | VOLT_MSB | VOLT_LSB )
432 *****/
433 case COMMAND_DOWNLINK_BALANCING_ON: {
434     uint16_t volt_msb = 0;
435     uint16_t volt_lsb = 0;
436
437     volt_msb = (((uint16_t)(rxbuf[3] & 0x0F)) << 8) & 0xFF00;
438     volt_lsb = (((uint16_t)(rxbuf[4] & 0xFF)) << 0) & 0x00FF;
439
440     balancing_volt = volt_msb | volt_lsb;
441     balancing_volt = 2620; //TEST
442
443 }break;
444
445 /******
446 ** Dekodierung des Burstheader
447 ** Paketzusammenstellung:
448 ** ( Adr. ZS | Kommando | Burst Freq | Anzahl Werte )
449 *****/
450 case COMMAND_DOWNLINK_BURST_MODE: {
451     burst_freq = rxbuf[2];
452     uint8_t burst_value = rxbuf[3];
453
454     switch(burst_value) {
455     case BURST_VALUES_50:
456         burst_values = 50;
457         break;
458
459     case BURST_VALUES_100:
460         burst_values = 100;
461         break;
462
463     case BURST_VALUES_150:
464         burst_values = 150;
465         break;
466
467     case BURST_VALUES_200:
468         burst_values = 200;
469         break;
470
471     case BURST_VALUES_250:
472         burst_values = 250;
473         break;
474
475     case BURST_VALUES_300:
476         burst_values = 300;
477         break;
478
479     case BURST_VALUES_350:
480         burst_values = 350;
481         break;
482
483     case BURST_VALUES_400:
484         burst_values = 400;
485         break;
486
487     case BURST_VALUES_450:
488         burst_values = 450;
489         break;
490
491     case BURST_VALUES_500:
492         burst_values = 500;
493         break;
494
495     case BURST_VALUES_550:
496         burst_values = 550;
497         break;
498
499     case BURST_VALUES_600:
500         burst_values = 600;
501         break;
502
503     case BURST_VALUES_650:
504         burst_values = 650;
505         break;
```



```
506
507         case BURST_VALUES_700:
508             burst_values = 700;
509         break;
510
511         case BURST_VALUES_750:
512             burst_values = 750;
513         break;
514
515         case BURST_VALUES_800:
516             burst_values = 800;
517         break;
518
519         case BURST_VALUES_850:
520             burst_values = 850;
521         break;
522
523         case BURST_VALUES_900:
524             burst_values = 900;
525         break;
526
527         case BURST_VALUES_1000:
528             burst_values = 1000;
529         break;
530
531         case BURST_VALUES_1500:
532             burst_values = 1500;
533         break;
534
535         case BURST_VALUES_1900:
536             burst_values = 1900;
537         break;
538
539         case BURST_VALUES_2000:
540             burst_values = 2000;
541         break;
542
543         case BURST_VALUES_2500:
544             burst_values = 2500;
545         break;
546     }
547 }
548
549
550
551
552     /**
553     ** Dekodierung des Burstheader
554     ** Paketzusammenstellung:
555     ** ( Adr. ZS | Kommando | Frame Nummer | 0x00 )
556     **/
557     case COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RX: {
558         frame_number = rxbuf[2];
559     }break;
560
561
562     /**
563     ** Dekodierung des Goertzelheader:
564     ** Paketzusammenstellung:
565     ** ( Adr. ZS | Kommando | Numb of pa. | 0x00 )
566     **/
567     case COMMAND_GOERTZEL_NUMB_PERI: {
568         uint16_t value = 0;
569
570         // Dekodierung der Signalfrequenz
571         value = (rxbuf[2]);
572         m = (float) value;
573     }break;
574
575
576     /**
577     ** Dekodierung des Goertzelheader:
578     ** Paketzusammenstellung:
579     ** ( Adr. ZS | Kommando | Sigantfreq. | Sigantfreq )
580     **/
581     case COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ: {
582         uint16_t value = 0;
583
584         // Dekodierung der Signalfrequenz
585         value = 100*(rxbuf[2]);
586         value = value + (rxbuf[3]);
587         f_goertzel = (float) value;
588     }break;
589
590     /**
```

```

591     ** Dekodierung des Goertzelheader:
592     ** Paketzusammenstellung:
593     ** ( Adr. ZS | Kommando | Signalfreq. | 0x00 )
594     *****/
595     case COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ2: {
596         uint16_t value = 0;
597
598         // Dekodierung der Signalfrequenz
599         value = (rxbuf[2]);
600         f_goertzel = f_goertzel + 0.1* (float) value;
601
602     }break;
603
604     /***/
605     ** Dekodierung des Goertzelheader:
606     ** Paketzusammenstellung:
607     ** ( Adr. ZS | Kommando | Signalfreq. | Signalfreq )
608     *****/
609     case COMMAND_GOERTZEL_FREQ: {
610         uint16_t value = 0;
611
612         // Dekodierung der Signalfrequenz
613         value = 100*(rxbuf[2]);
614         value = value + (rxbuf[3]);
615         Fs_goertzel = (float) value;
616
617     }break;
618
619     /***/
620     ** Dekodierung des Kalibrierungsheader: TMP102
621     ** Paketzusammenstellung:
622     ** ( Adr. ZS | Kommando | Pos. Offset | Neg. Offset )
623     *****/
624     case COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_TMP102: {
625         cali_pos_offset_tmp102 = rxbuf[2];
626         cali_neg_offset_tmp102 = rxbuf[3];
627     }break;
628
629     /***/
630     ** Dekodierung des Kalibrierungsheader: MSP430
631     ** Paketzusammenstellung:
632     ** ( Adr. ZS | Kommando | Pos. Offset | Neg. Offset )
633     *****/
634     case COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_MSP430: {
635         cali_pos_offset_msp430 = rxbuf[2];
636         cali_neg_offset_msp430 = rxbuf[3];
637     }break;
638
639     /***/
640     ** Dekodierung des Kalibrierungsheader: ADC
641     ** Paketzusammenstellung:
642     ** ( Adr. ZS | Kommando | Pos. Offset | Neg. Offset )
643     *****/
644     case COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_ADC: {
645         cali_pos_offset_adc = rxbuf[2];
646         cali_neg_offset_adc = rxbuf[3];
647     }break;
648
649     default: break;
650 }
651
652     }
653     led_off(LED_RX);
654 } else {
655     cc430_read_rx_fifo(rxbuf, bytes_in_fifo); //TODO CHECK. Dummy read to reset Rx Flag
656 }
657
658
659 //TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
660 _EINT(); // Globale Interrupts einschalten
661
662 } else if (IRQ_IS_TX) {
663     CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE;
664     //CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ; Seems to Auto-Clear TODO : Herausfinden , bei was Auto-Clear
665     irq_send_done_flag = 1;
666 }
667 break;
668
669 /***/
670 * Case 22: RFIFG10
671 * Positive edge: Packet received with CRC OK.
672 * Negative edge: First byte read from RX FIFO.
673 * This is equal to GDOx_CFG=7 on the CC1101 module
674 *****/
675 case RF1AIV_RFIFG10: break;

```

```

676
677  /*****
678  * Case 24: RFIFG11
679  * Positive edge: Preamble quality reached (PQI) is above programmed PQT value.
680  * Negative edge: (LPW)
681  * This is equal to GDOx_CFG=8 on the CC1101 module
682  *****/
683  case RF1AIV_RFIFG11: break;
684
685  /*****
686  * Case 26: RFIFG12
687  * Positive edge: Clear channel assessment when RSSI level is below threshold (dependent on the current RFIFG12
        CCA_MODE setting).
688  * Negative edge: RSSI level is above threshold.
689  * This is equal to GDOx_CFG=9 on the CC1101 module
690  *****/
691  case RF1AIV_RFIFG12: break;
692
693  /*****
694  * Case 28: RFIFG13
695  * Positive edge: Carrier sense. RSSI level is above threshold.
696  * Negative edge: RSSI level is below threshold.
697  * This is equal to GDOx_CFG=14 on the CC1101 module
698  *****/
699  case RF1AIV_RFIFG13: break;
700
701  /*****
702  * Case 30: RFIFG14
703  * Positive edge: WOR event 0
704  * Negative edge: WOR event 0 + 1 ACLK.
705  * This is equal to GDOx_CFG=36 on the CC1101 module
706  *****/
707  case RF1AIV_RFIFG14: break;
708
709  /*****
710  * Case 32: RFIFG15
711  * Positive edge: WOR event 1
712  * Negative edge: RF oscillator stable or next WOR event0 triggered.
713  * This is equal to Equal to GDOx_CFG=37 on the CC1101 module
714  *****/
715  case RF1AIV_RFIFG15: break;
716  }
717  }
718
719
720  /*****
721  ** IRQ Port1
722  *****/
723  #pragma vector=PORT1_VECTOR
724  __interrupt void PORT1_ISR(void) {
725      switch(__even_in_range(P1IV,16)) {
726          case P1IV_NONE: break;           // No Interrupt pending
727          /*****
728          case P1IV_P1IFG0: break;        // P1IV P1IFG.0
729          *****/
730          case P1IV_P1IFG1:               // P1IV P1IFG.1
731              // Temp IRQ Empfangeln
732
733              if(IRQ_ALERT_IS_LOW) {      // Anfrage Alarm auslösen
734
735                  TMP102_ALERT_IRQ_DISABLE; // Interrupt stoppen
736                  TMP102_ALERT_CLEAR_IRQ;
737
738                  // led_off(LED_AWAKE);
739                  IRQ_ALERT_SET_HIGH;     // Alarm setzen
740
741                  TMP102_SET_IRQ_RISING_EDGE; // IRQ auf steigende Flanke setzen
742                  TMP102_ALERT_CLEAR_IRQ;
743                  TMP102_ALERT_IRQ_ENABLE;
744
745              }else if(IRQ_ALERT_IS_HIGH) { // Anfrage Alarm zurücksetzen
746
747                  TMP102_ALERT_IRQ_DISABLE; // Interrupt stoppen
748                  TMP102_ALERT_CLEAR_IRQ;
749
750                  // led_on(LED_AWAKE);
751                  IRQ_ALERT_SET_LOW;      // Alarm löschen
752                  TMP102_SET_IRQ_FALLING_EDGE; // IRQ auf fallende Flanke setzen
753
754                  TMP102_ALERT_CLEAR_IRQ;
755                  TMP102_ALERT_IRQ_ENABLE;
756              }break;
757          /*****
758          case P1IV_P1IFG2: break;        // P1IV P1IFG.2
759          *****/

```

```

760     case P1IV_P1IFG3: break;           // P1IV P1IFG.3
761     /******
762     case P1IV_P1IFG4: break;           // P1IV P1IFG.4
763     /******
764     case P1IV_P1IFG5: break;           // P1IV P1IFG.5
765     /******
766     case P1IV_P1IFG6: break;           // P1IV P1IFG.6
767     /******
768     case P1IV_P1IFG7: break;           // P1IV P1IFG.7
769 }
770 }
771
772 /******
773 ** IRQ Port2
774 /******
775 #pragma vector=PORT2_VECTOR
776 __interrupt void PORT2_ISR(void) {
777     switch(__even_in_range(P2IV,16)) {
778     case P2IV_NONE: break; // No Interrupt
779     /******
780     case P2IV_P2IFG0: // P2IV P2IFG.0
781     /******
782     ** IRQ AD7691 testing
783     ** Readout the sampling date from the AD7691
784     ** The ADC values are stored in an 16 Bit array!!
785     /******
786     AD7691_BUSY_IRQ_DISABLE;
787     AD7691_BUSY_CLEAR_IRQ;
788
789     sample_burst_buf[burst_counter] = 0;
790
791     UCA0TXBUF = 0x00; // Send address and register
792     while (UCA0STAT & UCBUSY); // Wait for TX to finish
793     sample_burst_buf[burst_counter] |= (UCA0RXBUF & 0xFF); // Read data from buffer
794     sample_burst_buf[burst_counter] = sample_burst_buf[burst_counter] << 8; // Read data from buffer
795     UCA0TXBUF = 0x00; // Write dummy Byte
796     while (UCA0STAT & UCBUSY); // Wait for TX complete
797     sample_burst_buf[burst_counter] |= (UCA0RXBUF & 0xFF) << 0; // Read data from buffer
798
799     UCA0TXBUF = 0x00; // Write dummy Byte
800     while (UCA0STAT & UCBUSY); // Wait for TX complete
801
802     burst_counter++;
803
804     break;
805     /******
806     case P2IV_P2IFG1: break; // P2IV P2IFG.1
807     /******
808     case P2IV_P2IFG2: break; // P2IV P2IFG.2
809     /******
810     case P2IV_P2IFG3: break; // P2IV P2IFG.3
811     /******
812     case P2IV_P2IFG4: break; // P2IV P2IFG.4
813     /******
814     case P2IV_P2IFG5: // P2IV P2IFG.5
815     /******
816     ** IRQ Wakeup empfangen
817     /******
818     // Exit Low Power Mode 4
819     EXIT_LPM4;
820
821     // Disable and clear the wake interrupt as the sensor is awake now
822     AS3930_WAKE_IRQ_DISABLE;
823     AS3930_WAKE_CLEAR_IRQ;
824
825     //TMP102_SET_IRQ_FALLING_EDGE;
826     //TMP102_ALERT_IRQ_ENABLE;
827     //TMP102_ALERT_CLEAR_IRQ;
828
829     // Turn on the red LED
830     led_on(LED_AWAKE);
831     //TIMER_B_START;
832
833     // Change to RX state
834     adg918_transceiver(); // Connect the loop antenne with the transceiver
835     adc12_volt_init(clk_set,1); // Initialize ADC
836
837     state = S_WAKEUP;
838
839     rx_data_length = 0; // Standart Datenlänge empfangen
840     cc430_set_rx(brate_start);
841     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
842
843     break;
844     /******

```

```

845     case P2IV_P2IFG6:   break; // P2IV P2IFG.6
846     /******
847     case P2IV_P2IFG7:   break; // P2IV P2IFG.7
848     }
849 }
850
851 /******
852 ** IRQ Timer0 A0
853 ** Timer for the balancing function
854 *****/
855 #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
856 __interrupt void TIMER0_A0_ISR(void) {
857
858     if (IRQ_TIMER_A_IS_DELAY) {
859         __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);
860     }
861
862     if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
863
864         // Keine nested Interrupt
865         CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE;
866         CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
867
868         balancing_time++;
869
870         // 10min Balancieren -> 10min * 60sek * 2 = 1200
871         if (balancing_time < 1200) {
872
873             uint16_t actual_volt = 0x0000;
874             uint16_t actual_temp = 0x0000;
875
876             // Aktuelle Werte holen
877             actual_volt = adc12_get_volt_sample(clk_set);
878             actual_temp = temp_sensor_get_temp();
879
880             sample_buf_volt = actual_volt;
881
882             // Temperaturkontrolle
883             if (TEMP_IS_NORMAL) { // Temperatur ist Normal
884                 if (actual_temp > upper_balanc_temp) // Ist aktuelle Temp. zu hoch?
885                     TEMP_SET_HIGH;
886             } else if (TEMP_IS_HIGH) {
887                 if (actual_temp < lower_balanc_temp) // Ist aktuelle Temp. ok?
888                     TEMP_SET_NORMAL;
889             }
890
891             // Spannungskontrolle
892             if (actual_volt > balancing_volt) {
893                 if (TEMP_IS_NORMAL) {
894                     balancing_on();
895                 } else {
896                     balancing_off();
897                 }
898             } else { // Stop Balancing
899                 TIMER_A_STOP;
900                 balancing_off();
901                 balanc_state = OFF;
902                 IRQ_TIMER_A_UNSET_BALANCING;
903                 TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
904                 TIMER_A_1_CM_IRQ_DISABLE;
905             }
906         } else {
907             TIMER_A_STOP;
908             balancing_off();
909             balanc_state = OFF;
910             IRQ_TIMER_A_UNSET_BALANCING;
911             TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
912             TIMER_A_1_CM_IRQ_DISABLE;
913         }
914
915         if (balanc_state == OFF) {
916             TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
917             TIMER_A_1_CM_IRQ_DISABLE;
918         }
919
920         CC430_END_OF_PKT_IRQ_ENABLE;
921         CC430_GDO2_IRQ_ENABLE;
922     }
923 }
924
925 /******
926 ** IRQ Timer0 A1
927 ** Actually unused
928 *****/
929 #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR

```

```

930 __interrupt void TIMER0_A1_ISR(void) {
931     switch(__even_in_range(TA0IV,14)) {
932         case TA0IV_NONE: break; // No Interrupt pending
933         /******
934         case TA0IV_TACCR1: break; // TA0CCR1_CCIFG
935         /******
936         case TA0IV_TACCR2: break; // TA0CCR2_CCIFG
937         /******
938         case TA0IV_TACCR3: break; // TA0CCR3_CCIFG
939         /******
940         case TA0IV_TACCR4: break; // TA0CCR4_CCIFG
941         /******
942         case TA0IV_5: break; // Reserved
943         /******
944         case TA0IV_6: break; // Reserved
945         /******
946         case TA0IV_TAIFG: break; // TA0IFG Timer Overflow
947     }
948 }
949
950 /******
951 ** IRQ Timer1 A0
952 ** This timer close the time slice for the burst measurement
953 /******
954 #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
955 __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void) {
956     //TA1CCR0 CCIFG
957     if (IRQ_TIMERB_IS_BURST) {
958         if (burst_counter >= burst_values) { //Sind alles Werte durchgekommen
959
960             CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
961             CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
962
963             TIMER_B_STOP;
964             TIMER_B_0_CM_IRQ_DISABLE;
965             TIMER_B_1_CM_IRQ_DISABLE;
966
967             burst_error = 0; // Burst error zurücksetzen
968
969             //Flag zurücksetzen
970             TIMER_B_FLAG_RESET;
971
972             IRQ_TIMERB_UNSET_BURST;
973             rx_command = COMMAND_BACK_FROM_BURST;
974             command_received = 1;
975
976         } else { //Fehler wird dedektiert
977             BURST_ERROR_FLAG_SET; // Fehlerflag setzen
978
979             // bei hohen Frequenzen gibt es keine Fensterung mehr, Interrupt bleibt freigeschalten
980             if (burst_freq >= BURST_FREQ_2000HZ) {
981                 CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
982                 CC430_GDO2_IRQ_ENABLE;
983
984                 //Flag zurücksetzen
985                 TIMER_B_FLAG_RESET;
986             } else {
987                 // Close the time slice
988                 CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
989                 CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
990             }
991
992             // Timer einstellen
993             timer_b_init_burst(burst_freq);
994
995             // Timer starten
996             TIMER_B_START_UP_MODE;
997
998             //sample_burst_buf[burst_counter] = 0xFFFF; // Fehlerwert
999             burst_counter++; // Burstcounter hochzählen
1000             burst_error++; // Burstfehler hochzählen
1001         }
1002     }
1003
1004     /******
1005     * Counter for the delay function
1006     /******
1007 } else if (IRQ_TIMERB_IS_DELAY) {
1008     delay_counter++;
1009 } else if (IRQ_TIMERB_IS_CLOCK_CALI) { // Interrupt for the clock calibration
1010     clk_cali_counter++;
1011 }
1012 }
1013 }
1014

```

```
1015
1016 /*****
1017 ** IRQ Timer1 A1
1018 ** TACCR1 open the time slice for the burst measurement
1019 *****/
1020 #pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
1021 __interrupt void TIMER1_A1_ISR(void) {
1022     switch(__even_in_range(TA1IV,14)) {
1023
1024         case TA1IV_NONE:    break; // No Interrupt pending
1025         /*****/
1026         case TA1IV_TACCR1:  // TA1CCR1_CCIFG
1027             // 528 Zeit für ISR abarbeitung bis Timer startet
1028             // test = TBR + 528;
1029             if (IRQ_TIMERB_IS_BURST) {
1030                 // Interrupt enablen
1031                 CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
1032                 AD7691_CS_DISABLE; // AD7691 testing
1033                 if (burst_counter < burst_values)
1034                     CC430_GDO2_IRQ_ENABLE;
1035
1036                 // Flag zurücksetzen
1037                 TIMER_B_FLAG_RESET;
1038             } break;
1039         /*****/
1040         case TA1IV_TACCR2:  break; // TA1CCR2_CCIFG
1041         /*****/
1042         case TA1IV_3:       break; // Reserved
1043         /*****/
1044         case TA1IV_4:       break; // Reserved
1045         /*****/
1046         case TA1IV_5:       break; // Reserved
1047         /*****/
1048         case TA1IV_6:       break; // Reserved
1049         /*****/
1050         case TA1IV_TAIFG:   break; // TA1IFG Timer Overflow
1051     }
1052 }
```

```

1  /*****
2  **   Description   : led.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 09/12/2014
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10
11 void led_init (void) {
12     LED_RED_PxDIR   |= LED_RED_PIN;
13     LED_YELLOW_PxDIR |= LED_YELLOW_PIN;
14     LED_GREEN_PxDIR  |= LED_GREEN_PIN;
15     led_off(LED_ALL);
16 }
17
18 void led_on (LED_t led) {
19     #ifdef ENABLE_LEDS
20     switch (led) {
21         case LED_AWAKE:    LED_RED_PxOUT   |= LED_RED_PIN;
22                             break;
23
24         case LED_TX:       LED_YELLOW_PxOUT |= LED_YELLOW_PIN;
25                             break;
26
27         case LED_RX:       LED_GREEN_PxOUT  |= LED_GREEN_PIN;
28                             break;
29
30         case LED_ALL:      led_on(LED_AWAKE);
31                             led_on(LED_TX);
32                             led_on(LED_RX);
33                             break;
34
35         default :         break;
36     }
37     #endif /* ENABLE_LEDS */
38 }
39
40 void led_off (LED_t led) {
41
42     switch (led) {
43         case LED_AWAKE:    LED_RED_PxOUT   &= ~LED_RED_PIN;
44                             break;
45
46         case LED_TX:       LED_YELLOW_PxOUT &= ~LED_YELLOW_PIN;
47                             break;
48
49         case LED_RX:       LED_GREEN_PxOUT  &= ~LED_GREEN_PIN;
50                             break;
51
52         case LED_ALL:      led_off(LED_AWAKE);
53                             led_off(LED_TX);
54                             led_off(LED_RX);
55                             break;
56
57         default :         break;
58     }
59 }
60
61 void led_toggle (LED_t led) {
62     #ifdef ENABLE_LEDS
63
64     switch (led) {
65         case LED_AWAKE:    LED_RED_PxOUT   ^= LED_RED_PIN;
66                             break;
67
68         case LED_TX:       LED_YELLOW_PxOUT ^= LED_YELLOW_PIN;
69                             break;
70         case LED_RX:       LED_GREEN_PxOUT  ^= LED_GREEN_PIN;
71                             break;
72
73         case LED_ALL:      led_toggle(LED_AWAKE);
74                             led_toggle(LED_TX);
75                             led_toggle(LED_RX);
76                             break;
77
78         default :         break;
79     }
80     #endif /* ENABLE_LEDS */
81 }

```



```

1  /*****
2  **   Description   : main.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date         : 06/03/2013
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10
11  volatile uint8_t state = 0;
12
13  /*****
14  // System settings and clock rate
15  *****/
16  volatile uint8_t clk_set      = 1;
17  volatile uint16_t sw_version   = 320;
18  volatile uint32_t dco_value    = DCO_MP_16MHZ;
19
20  /*****
21  ** RX
22  *****/
23  volatile uint8_t rx_command   = COMMAND_WAIT;
24  volatile uint8_t rx_data_length = 0;
25  volatile uint8_t tx_data_length = 0;
26
27  /*****
28  ** TX
29  *****/
30  volatile uint8_t packet[64] = {0}; // TX packet
31
32  /*****
33  ** Balancing
34  *****/
35  volatile uint16_t balancing_volt = 0x500; // Zielwert der Balancierung
36  volatile uint16_t balancing_time = 0x000;
37  volatile uint8_t balanc_state    = OFF;
38  volatile uint8_t temp_state     = TEMP_NORMAL;
39  volatile uint16_t upper_balanc_temp = 0x250;
40  volatile uint16_t lower_balanc_temp = 0x200;
41  volatile uint16_t upper_alarm_temp = 0x1A00;
42  volatile uint16_t lower_alarm_temp = 0x1900;
43
44  /*****
45  ** Data buffer
46  *****/
47  volatile uint16_t config_value;
48  volatile uint16_t sample_burst_buf[BURST_VALUES];
49  volatile uint16_t sample_buf_volt; // The latest cell voltage sample
50  volatile uint16_t sample_buf_temp;
51  volatile uint16_t sample_buf_temp_msp;
52
53  /*****
54  ** Burst Mode
55  *****/
56  volatile uint8_t burst_freq = 0; // Burst Frequenz
57  volatile uint16_t burst_values = 0; // Anzahl der erwarteten Burst Werte
58  volatile uint16_t burst_counter = 0; // Counter der Burst-Werte
59  volatile uint16_t burst_memory = 0; // Counter der Burst-Speichers
60  volatile uint8_t burst_frame_counter = 0;
61  volatile uint8_t burst_frame_lenght = 48; // 50 -> 25 Werten
62  volatile uint8_t frame_number = 0;
63  volatile uint8_t burst_error = 0;
64  volatile uint8_t burst_error_flag = 0;
65
66  /*****
67  ** Goertzel
68  *****/
69  volatile float Fs_goertzel = 0.0; // Burstfrequenz
70  volatile float f_goertzel = 0.0; // Signal frequency
71  volatile float m = 0.0;
72  //volatile float burst_lenght = 0.0;
73  float real;
74  float imag;
75  float bn_0 = 0;
76  float bn_1 = 0;
77  float bn_2 = 0;
78  float N_float;
79  float omega;
80  float sine;
81  float cosine;
82  float coeff;
83
84  float Np;
85

```

```

86 float f_gain = 0.0;
87 float f_voltage = 0.0;
88
89 uint16_t goertzel_index = 0;
90
91
92 typedef union {
93     float float_data;
94     unsigned char hex_data[4];
95 } FB;
96
97 FB real_char;
98 FB imag_char;
99
100 /*****
101 ** AD5270
102 *****/
103 volatile uint16_t ad5270_1_value;
104 volatile uint16_t ad5270_2_value;
105
106 /*****
107 ** Kalibrierung
108 *****/
109 volatile uint8_t cali_pos_offset_tmp102 = 0;
110 volatile uint8_t cali_neg_offset_tmp102 = 0;
111 volatile uint8_t cali_pos_offset_msp430 = 0;
112 volatile uint8_t cali_neg_offset_msp430 = 0;
113 volatile uint8_t cali_pos_offset_adc = 0;
114 volatile uint8_t cali_neg_offset_adc = 0;
115 volatile uint32_t clk_cali_counter = 0; // Counter for the clock calibration
116
117 /*****
118 ** ADC Select
119 *****/
120 volatile uint8_t adc_mode = ADC12_INT_SELECT;
121
122 /*****
123 ** Interruptflags
124 *****/
125 volatile uint8_t irq_mode = TX_MODE; // PORT1 IRQ Status
126 volatile uint8_t irq_send_done_flag = 0; // cc430 senden
127 volatile uint8_t irq_alert = 0; // TMP102 Alarm
128 volatile uint8_t irq_timera = 0; // Status TimerA
129 volatile uint8_t irq_timerb = 0; // Status TimerB
130 volatile uint8_t cali_flag = 0; // Burst Cali flag
131 volatile uint8_t irq_cali_flag = 0; // Flag for burst calibration
132
133 /*****
134 ** Communication states
135 *****/
136 volatile uint8_t command_recived = 0;
137 volatile uint8_t wakeup_state = 0x00;
138
139 volatile uint8_t brate_start = 100;
140 volatile uint8_t brate = 100;
141
142 volatile uint16_t delay_counter = 0;
143
144 volatile uint8_t gdo0_state = 0x00;
145 volatile uint8_t burst_cali_flag = 0;
146
147 /*****
148 // Preprocessing
149 *****/
150 volatile uint16_t gain = 0x0000;
151 volatile uint16_t offset = 0x03FF;
152
153 void main(void) {
154     WDTCIL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
155     // WDTCIL = WDT_MDLY_32; // WDT as interval timer (period 0,5 ms)
156     // SFRIF1=WDTE; //enable the interrupt
157
158
159     /*****
160     ** PSEL
161     ** PDIR
162     ** PIDIR
163     ** POUT
164     *****/
165     PIDIR |= BIT4; // Testport
166     POUT &= ~BIT4; // Off
167
168     /*****
169     ** Initialisierung
170     *****/
171     init();

```

```

171 // Disable and clear the wake interrupt as the sensor is awake now
172 AS3930_WAKE_IRQ_DISABLE;
173 AS3930_WAKE_CLEAR_IRQ;
174
175 // Configure packet received interrupt
176 CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ;
177 CC430_END_OF_PKT_IRQ_ENABLE;
178
179 // Turn on the red LED
180 led_on(LED_AWAKE);
181
182 // Change to RX state
183 adg918_transceiver(); // Connect the loop antenne with the transceiver
184 adc12_volt_init(clk_set, 1); // Initialize ADC
185
186 state = S_WAKEUP;
187
188 rx_data_length = 0; // Standart Datenlänge empfangen
189 cc430_set_rx(brate_start);
190 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
191
192 write_AD5270_1(0x3FF);
193 write_AD5270_2(0x000);
194 SFRIF11=WDTIME; //enable the interrupt
195
196 // tx_carrier();
197
198 /******
199 ** Endless loop
200 *****/
201 while(1) {
202     if(command_recived > 0) { // Kommando wurde Empfangen
203         // Determine what the base station wants this sensor to do now
204         switch(rx_command) {
205             /******
206             ** Unbekanntes Kommando empfangen
207             *****/
208             case COMMAND_DOWNLINK_UNKOWN: {
209
210                 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
211             } break;
212
213             /******
214             ** Kommando zum WAKEUP empfangen
215             *****/
216             case COMMAND_WAKEUP: {
217                 state = S_WAKEUP_RX;
218
219                 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
220             } break;
221
222             /******
223             ** Kommando WAKUP DONE empfangen
224             *****/
225             case COMMAND_WAKEUP_DONE: {
226                 state = S_WAKEUP_DONE;
227
228                 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
229             } break;
230
231             /******
232             ** Set the first AD5270 1
233             *****/
234             case COMMAND_AD5270_1: {
235                 uint16_t value = 0;
236
237                 value = (ad5270_1_value << 8);
238                 value|= (ad5270_2_value << 0);
239
240                 write_AD5270_1(value);
241
242                 offset = value;
243
244                 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
245             } break;
246
247             /******
248             ** Set the second AD5270 2
249             *****/
250             case COMMAND_AD5270_2: {
251                 uint16_t value = 0;
252
253                 value = (ad5270_1_value << 8);
254                 value|= (ad5270_2_value << 0);
255
256                 write_AD5270_2(value);

```

```

256
257         gain = value;
258
259         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
260
261     } break;
262
263     /* *****
264     ** Senden des AWAKE Test
265     ***** */
266     case COMMAND_DOWNLINK_IS_AWAKE: {
267
268         //
269         uint8_t packet[HEADER_LENGTH] = {0};
270
271         packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
272         packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
273         packet[2] = 0x01;
274         packet[3] = 0x00;
275
276         cc430_tx(HEADER_LENGTH, packet);
277
278         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
279
280     } break;
281
282     /* *****
283     ** Einstellung zum Empfang von Konfigurationen
284     ***** */
285     case COMMAND_DOWNLINK_CONFIG_SET: {
286
287         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
288     } break;
289
290     /* *****
291     ** Konfiguration empfangen, danach neu Konfigurieren
292     ***** */
293     case COMMAND_DOWNLINK_CONFIG: {
294
295         /* *****
296         ** Temperatursensor konfigurieren
297         ***** */
298         temp_sensor_set_alert(lower_alarm_temp, upper_alarm_temp);
299
300         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
301     } break;
302
303     /* *****
304     ** Kalibrierung des TMP102
305     ***** */
306     case COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_TMP102: {
307
308         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
309     } break;
310
311     /* *****
312     ** Kalibrierung des MSP430
313     ***** */
314     case COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_MSP430: {
315
316         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
317     } break;
318
319     /* *****
320     ** Aufnahme der einfachen Spannungs- und Temp.-Messung
321     ***** */
322     case COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE_TEMPERATURE: {
323
324         // IRQ TimerA anhalten
325         // Da Interrupt stört NS 27.06.13
326         if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
327             TIMER_A_STOP;
328             TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
329         }
330
331         if (balanc_state == OFF) //TEST
332             sample_buf_volt = adc12_get_volt_sample(clk_set);
333
334         sample_buf_temp = temp_sensor_get_temp();
335         sample_buf_temp = sample_buf_temp + cali_pos_offset_tmp102;
336         sample_buf_temp = sample_buf_temp - cali_neg_offset_tmp102;
337
338         // IRQ TimerA vortsetzen
339
340

```

```

341         if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
342             TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
343             TIMER_A_START_UP_MODE;
344         }
345     }
346     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
347 } break;
348
349 /******
350 ** Senden der einfachen Spannungs- und Temp.-Messung
351 *****/
352 case COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE: {
353
354     //      uint8_t packet[8];
355
356     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
357     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
358     packet[2] = COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE;
359     packet[3] = 0x00;
360
361     packet[4] = (uint8_t)((sample_buf_volt >> 8) & 0x0F);
362     packet[5] = (uint8_t)((sample_buf_volt >> 0) & 0xFF);
363
364     packet[6] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 8) & 0x0F);
365     packet[7] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 0) & 0xFF);
366
367     cc430_tx(8, packet);
368
369     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
370 } break;
371
372 /******
373 ** Senden der Konfigurationsinformationen
374 *****/
375 case COMMAND_SW: {
376
377     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
378     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
379     packet[2] = COMMAND_SW;
380     packet[3] = 0x00;
381
382     packet[4] = sw_version;
383     packet[5] = adc_mode;
384     packet[6] = brate;
385
386     packet[7] = burst_frame_length;
387
388     packet[8] = (balancing_volt >> 8) & 0xFF;
389     packet[9] = (balancing_volt >> 0) & 0xFF;
390
391     packet[10] = (upper_balanc_temp >> 8) & 0xFF;
392     packet[11] = (upper_balanc_temp >> 0) & 0xFF;
393
394     packet[12] = (lower_balanc_temp >> 8) & 0xFF;
395     packet[13] = (lower_balanc_temp >> 0) & 0xFF;
396
397     packet[14] = (upper_alarm_temp >> 8) & 0xFF;
398     packet[15] = (upper_alarm_temp >> 0) & 0xFF;
399
400     packet[16] = (lower_alarm_temp >> 8) & 0xFF;
401     packet[17] = (lower_alarm_temp >> 0) & 0xFF;
402
403     packet[18] = (offset >> 8) & 0x0F;
404     packet[19] = (offset >> 0) & 0xFF;
405
406     packet[20] = (gain >> 8) & 0x0F;
407     packet[21] = (gain >> 0) & 0xFF;
408
409     cc430_tx(22, packet);
410
411     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
412 } break;
413
414 /******
415 ** Aufnahme der einfachen Spannungs- und Temp.-Messung
416 *****/
417 case COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE_TEMPERATURE_ALL: {
418
419     // IRQ TimerA anhalten
420     // Da Interrupt stört NS 27.06.13
421     if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
422         TIMER_A_STOP;

```

```
426         TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
427     }
428
429     sample_buf_volt = adc12_get_volt_sample(clk_set);
430
431     sample_buf_temp = temp_sensor_get_temp();
432     sample_buf_temp = sample_buf_temp + cali_pos_offset_tmp102;
433     sample_buf_temp = sample_buf_temp - cali_neg_offset_tmp102;
434
435     sample_buf_temp_msp = adc12_get_temp_sample(clk_set);
436
437     // IRQ TimerA vortsetzen
438     if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
439         TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
440         TIMER_A_START_UP_MODE;
441     }
442
443     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
444 } break;
445
446 /******
447 ** Senden der einfachen Spannungs- und Temp.-Messung
448 *****/
449 case COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE_ALL: {
450
451     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
452     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
453     packet[2] = COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE;
454     packet[3] = 0x00;
455
456     packet[4] = (uint8_t)((sample_buf_volt >> 8) & 0x0F);
457     packet[5] = (uint8_t)((sample_buf_volt >> 0) & 0xFF);
458
459     packet[6] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 8) & 0x0F);
460     packet[7] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 0) & 0xFF);
461
462     packet[8] = (uint8_t)((sample_buf_temp_msp >> 8) & 0x0F);
463     packet[9] = (uint8_t)((sample_buf_temp_msp >> 0) & 0xFF);
464
465     cc430_tx(10, packet);
466
467     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
468 } break;
469
470 /******
471 ** Aufnahme der einfachen Temperaturmessung
472 ** mit TMP102
473 *****/
474 case COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_TMP102: {
475
476     if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
477         TIMER_A_STOP;
478         TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
479     }
480
481     sample_buf_temp = temp_sensor_get_temp();
482     sample_buf_temp = sample_buf_temp + cali_pos_offset_tmp102;
483     sample_buf_temp = sample_buf_temp - cali_neg_offset_tmp102;
484
485     // IRQ TimerA vortsetzen
486     if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
487         TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
488         TIMER_A_START_UP_MODE;
489     }
490
491     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
492 } break;
493
494 /******
495 ** Senden der einfachen Temperaturmessung
496 ** mit TMP102
497 *****/
498 case COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102: {
499
500     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
501     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
502     packet[2] = COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102;
503     packet[3] = 0x00;
504
505     packet[4] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 8) & 0x0F);
506     packet[5] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 0) & 0xFF);
507
508     cc430_tx(6, packet);
509
510 }
```

```

511         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
512     } break;
513
514     /**
515     ** Aufnahme der einfachen Temperaturmessung
516     ** mit TMP102 zur Kalibrierung
517     ****
518     ****
519     case COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_TMP102_CALI: {
520
521         // IRQ TimerA anhalten
522         // Da Interrupt stört NS 27.06.13
523         if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
524             TIMER_A_STOP;
525             TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
526         }
527
528         sample_buf_temp = temp_sensor_get_temp();
529
530         // IRQ TimerA vortsetzen
531         if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
532             TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
533             TIMER_A_START_UP_MODE;
534         }
535
536         delay_ms(1);
537
538         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
539     } break;
540
541     /**
542     ** Senden der einfachen Temperaturmessung
543     ** mit TMP102 zur Kalibrierung
544     ****
545     ****
546     case COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102_CALI: {
547
548         packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
549         packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
550         packet[2] = COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102_CALI;
551         packet[3] = 0x00;
552
553         packet[4] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 8) & 0x0F);
554         packet[5] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 0) & 0xFF);
555
556         cc430_tx(6, packet);
557
558         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
559     } break;
560
561     /**
562     ** Aufnahme der einfachen Temperaturmessung
563     ** mit MSP430 zur Kalibrierung
564     ****
565     ****
566     case COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_MSP430_CALI: {
567
568         sample_buf_temp_msp = adc12_get_temp_sample(c1k_set);
569         delay_ms(1);
570
571         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
572     } break;
573
574     /**
575     ** Senden der einfachen Temperaturmessung
576     ** mit MSP430 zur Kalibrierung
577     ****
578     ****
579     case COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430_CALI: {
580
581         packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
582         packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
583         packet[2] = COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430_CALI;
584         packet[3] = 0x00;
585
586         packet[4] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 8) & 0x0F);
587         packet[5] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 0) & 0xFF);
588
589         cc430_tx(6, packet);
590
591         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
592     } break;
593
594     /**
595     ** Aufnahme der einfachen Temperaturmessung
596     ** mit MSP430
597     ****
598     ****
599     case COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_MSP430: {

```

```

596
597     sample_buf_temp = adc12_get_temp_sample(clk_set);
598     sample_buf_temp = sample_buf_temp + cali_pos_offset_msp430;
599     sample_buf_temp = sample_buf_temp - cali_neg_offset_msp430;
600     delay_ms(1);
601
602     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
603 } break;
604
605 /******
606 ** Senden der einfachen Temperaturmessung
607 ** mit MSP430
608 *****/
609 case COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430: {
610
611     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
612     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
613     packet[2] = COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430;
614     packet[3] = 0x00;
615
616     packet[4] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 8) & 0x0F);
617     packet[5] = (uint8_t)((sample_buf_temp >> 0) & 0xFF);
618
619     cc430_tx(6, packet);
620
621     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
622 } break;
623
624 /******
625 ** Aufnahme der einfachen Spannungsmessung
626 *****/
627 case COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE: {
628
629     sample_buf_volt = adc12_get_volt_sample(clk_set);
630     delay_ms(10);
631
632     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
633 } break;
634
635 /******
636 ** Senden der einfachen Spannungsmessung
637 *****/
638 case COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE: {
639
640     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
641     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
642     packet[2] = 0x00; //COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE;
643     packet[3] = 0x00;
644
645     packet[4] = (uint8_t)((sample_buf_volt >> 8) & 0x0F);
646     packet[5] = (uint8_t)((sample_buf_volt >> 0) & 0xFF);
647
648     cc430_tx(6, packet);
649
650     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
651 } break;
652
653 /******
654 ** Kommando zum Balancing empfangen
655 *****/
656 case COMMAND_DOWNLINK_BALANCING_ON: {
657     timer_a_init_balanc(); // TimerA wird initialisiert
658     TIMER_A_START_UP_MODE;
659     balanc_state = ON;
660
661     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
662 } break;
663
664 /******
665 ** Kommando zum Balancing ausschalten empfangen
666 *****/
667 case COMMAND_DOWNLINK_BALANCING_OFF: {
668     TIMER_A_STOP;
669     balancing_off();
670     balanc_state = OFF;
671
672     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
673 } break;
674
675 /******
676 ** Command to set the analog preprocessing
677 *****/
678 case COMMAND_SET_PREPROCESSING: {

```



```

681
682     uint16_t voltage = 0;
683     uint16_t voltage_temp = 0;
684     uint16_t value = 0;
685     uint16_t data;
686     uint8_t index = 0;
687
688     clk_init_MHz(16);           // DCO auf 16 MHz setzen
689     clk_set = 16;             // CLK ist auf 16MHz gesetzt
690
691     // Interrupt sperren
692     CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
693     CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
694
695     cc430_init_burst();        // Auf Empfang konfigurieren
696     cc430_reset();           // cc430 reset
697     cc430_config_no_packet_rx(); // Auf asynchronen Empfang stellen
698     cc430_burst_rx();        // Ab hier wird empfangen
699     IRQ_SET_BURST;           // IRQ auf Burst Mode stellen
700
701     adc12_volt_init(clk_set,2); // Initialize ADC auf 16 MHz
702     delay_ms(100);
703
704     // Verstärkung auf Null setzen
705     write_AD5270_2(0x000);
706
707     // Minimale Spannung Abziehen
708     write_AD5270_1(0x000);
709
710     delay_ms(10);
711     voltage = adc12_get_volt_sample(clk_set);
712
713     // Spannung auf Zielwert einstellen oder maximal abziehen
714     while((voltage >= 30) && (value < 0x3FF)) {
715
716         led_on(LED_TX);
717         value++;
718         write_AD5270_1(value);
719
720         for(index=0;index < 20;index++) {
721
722             delay_ms(1);
723             data = adc12_get_volt_sample(clk_set);
724
725             voltage = voltage + data;
726         }
727         voltage = voltage/20;
728
729         led_off(LED_TX);
730     }
731
732     offset = value;
733
734     value = 0;
735     voltage = 0;
736
737     // Verstärkung einstellen
738     while((voltage <= 4000) && (value < 0x3FF)) {
739         led_on(LED_RX);
740         value++;
741         write_AD5270_2(value);
742
743         for(index=0;index < 20;index++) {
744             delay_ms(1);
745             voltage_temp = adc12_get_volt_sample(clk_set);
746
747             // Nach dem größten Wert suchen
748             if(voltage < voltage_temp)
749                 voltage = voltage_temp;
750         }
751         delay_ms(1);
752         led_off(LED_RX);
753     }
754
755     // gain = 1 + ((97*value)/1000);
756     gain = value;
757
758     clk_init_MHz(1);           // DCO auf 1 MHz setzen
759     clk_set = 1;             // CLK ist auf 1 MHz gesetzt
760
761     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
762
763 } break;
764
765 /******

```

```

766     ** Kommando zur Burstmessung
767     *****/
768     case COMMAND_DOWNLINK_BURST_MODE: {
769
770         clk_init_MHz(16);           // DCO auf 16 MHz setzen
771         clk_set = 16;              // CLK ist auf 16MHz gesetzt
772
773         adc12_volt_init(clk_set,2); // Initialize ADC auf 16 MHz
774         burst_counter = 0;         // Zurücksetzen
775         burst_memory = 0;
776         //init_ad7691();           // AD7691 testing
777         led_off(LED_ALL);
778
779         // Interrupt sperren
780         CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
781         CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
782
783         // IRQ TimerA anhalten
784         // Da Interrupt stört NS 27.06.13
785         if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
786             TIMER_A_STOP;
787             TIMER_A_0_CM_IRQ_DISABLE;
788         }
789
790         cc430_init_burst();         // Auf Empfang konfigurieren
791         cc430_reset();             // cc430 reset
792         cc430_config_no_packet_rx(); // Auf asynchronen Empfang stellen
793         cc430_burst_rx();         // Ab hier wird empfangen
794         IRQ_SET_BURST;            // IRQ auf Burst Mode stellen
795         delay_ms(32);             // Wartezeit
796
797         // Interrupt freischalten
798         CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
799         CC430_GDO2_IRQ_ENABLE;
800         // Ab hier wird Interruptgesteuert empfangen
801
802         command_recived = 0;
803     } break;
804
805     /***/
806     ** Kommando wenn vorher BURST MODE war, um CLK unzustellen
807     *****/
808     case COMMAND_BACK_FROM_BURST: {
809
810         _DINT();                  // Globale Interrupts ausschalten
811         clk_init_MHz(1);         // CLK auf 1MHz setzen
812         _EINT();                 // Globale Interrupts einschalten
813
814         // Turn on the red LED
815         led_on(LED_AWAKE);
816
817         // IRQ TimerA fortsetzen
818         // Da Interrupt stört NS 27.06.13
819         if (IRQ_TIMER_A_IS_BALANCING) {
820             TIMER_A_START_UP_MODE;
821             TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
822         }
823
824         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
825     } break;
826
827     /***/
828     ** Leersendung
829     *****/
830     case COMMAND_DOWNLINK_BURST_CHECK: {
831
832         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
833     } break;
834
835     /***/
836     ** Anfrage der Burst Daten
837     *****/
838     case COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RQ: {
839         // Berechnung der Anzahl der Frames
840         uint16_t index = burst_counter;
841         // burst_counter = 0; // Zurücksetzen
842         burst_frame_counter = 0; // Zurücksetzen
843
844         while(index >= (burst_frame_lenght/2)) {
845             burst_frame_counter++;
846             index = index - (burst_frame_lenght/2);
847         }
848         //if(index != 0) // Berechnung wenn weniger als (burst_frame_lenght/2) übrig bleibt
849         // burst_frame_counter++;
850     }

```

```

851
852     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
853     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
854     packet[2] = burst_frame_counter; // Anzahl der Frames
855     packet[3] = burst_frame_lenght; // Länge der Frames ohne Header
856
857     cc430_tx(4, packet);
858
859     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
860 } break;
861
862 /******
863 ** Receive the Goertzel Frequency
864 *****/
865 case COMMAND_GOERTZEL_FREQ: {
866     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
867 } break;
868
869 /******
870 ** Receive the Goertzel stimuli Frequency
871 *****/
872 case COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ: {
873     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
874 } break;
875
876 /******
877 ** Receive the Goertzel stimuli Frequency
878 *****/
879 case COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ2: {
880     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
881 } break;
882
883 /******
884 ** Receive the Goertzel number of periodes
885 *****/
886 case COMMAND_GOERTZEL_NUMB_PERI: {
887     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
888 } break;
889
890 /******
891 ** Calculate the Goertzel
892 *****/
893 case COMMAND_GOERTZEL: {
894
895     int k;
896     int N_int;
897     int mod = 0;
898
899     uint16_t data = 0;
900     uint16_t goertzel_memory_counter = 0;
901
902     real_char.float_data = 0.0;
903     imag_char.float_data = 0.0;
904
905     f_gain = 1 + (gain*(100000/1024))/1000;
906
907     bn_0 = 0; // Reset the coefficients
908     bn_1 = 0; // Reset the coefficients
909     bn_2 = 0; // Reset the coefficients
910
911     /******
912     Np = Fs_goertzel/f_goertzel; // Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
913     N_float = m * Np; // Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
914     N_int = (int) N_float;
915
916     k = (int) (0.5 + ((N_float * f_goertzel) / Fs_goertzel));
917     omega = (2.0 * 3.141592654 * k) / N_float;
918     sine = sinf(omega);
919     cosine = cosf(omega);
920     coeff = 2.0 * cosine;
921
922     /**** BEGIN the Goertzel algorithm ***//
923     for (goertzel_index = 0; goertzel_index < N_int+1; goertzel_index++) {
924
925         if(goertzel_index == N_int) { // The last value in the calculation have to be zero
926             bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + 0;
927         } else {
928             // Dekodieren der Daten
929             mod = goertzel_index % 4;
930
931             if(mod == 0){
932                 data = (sample_burst_buf[goertzel_memory_counter] >> 4) & 0x0FFF;
933             } else if(mod == 1){
934

```

```

936         data = (sample_burst_buf[goertzel_memory_counter] << 8) & 0x0F00;
937         goertzel_memory_counter++;
938
939         data |= (sample_burst_buf[goertzel_memory_counter] >> 8) & 0x00FF;
940
941     } else if (mod == 2) {
942         data = (sample_burst_buf[goertzel_memory_counter] << 4) & 0x0FF0;
943         goertzel_memory_counter++;
944
945         data |= (sample_burst_buf[goertzel_memory_counter] >> 12) & 0x000F;
946
947     } else if (mod == 3) {
948         data = (sample_burst_buf[goertzel_memory_counter] >> 0) & 0x0FFF;
949         goertzel_memory_counter++;
950     }
951
952     // f_voltage = ((2.5/4095)*data)/f_gain;
953     f_voltage = (((0.000568986)*data)/f_gain);
954
955     bn_0 = coeff * bn_1 - bn_2 + f_voltage;
956 }
957
958     bn_2 = bn_1;
959     bn_1 = bn_0;
960 }
961
962     real = (bn_1 - bn_2 * cosine);
963     imag = (bn_2 * sine);
964
965     real_char.float_data = real;
966     imag_char.float_data = imag;
967
968     /*** End the Goertzel algorithm ***/
969
970     packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
971     packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
972     packet[2] = 0x00;
973     packet[3] = 0x00;
974
975     packet[4] = real_char.hex_data[3];
976     packet[5] = real_char.hex_data[2];
977     packet[6] = real_char.hex_data[1];
978     packet[7] = real_char.hex_data[0];
979
980     packet[8] = imag_char.hex_data[3];
981     packet[9] = imag_char.hex_data[2];
982     packet[10] = imag_char.hex_data[1];
983     packet[11] = imag_char.hex_data[0];
984
985     delay_ms(50);
986
987     tx_data_length = 8;
988     cc430_tx((HEADER_LENGTH + tx_data_length), packet);
989
990     rx_data_length = 0;
991     cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
992 } break;
993
994
995     /*** Send burst data to the battery controller ***/
996     /*** Send the burst data to the battery controller ***/
997     /*** Send the burst data to the battery controller ***/
998     case COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RX: {
999         uint8_t gain_value = 0x00;
1000         uint16_t seq_number = 0;
1001         uint8_t sample_counter = 0;
1002         uint8_t packages_counter = 0;
1003
1004         packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
1005         packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
1006
1007         // Coding the gain value and the selected ADC
1008         gain_value = (adc_mode << 7);
1009         gain_value |= (gain >> 8);
1010
1011         packet[2] = gain_value; // Welcher ADC wurde verwendet
1012         packet[3] = gain & 0xFF;
1013
1014
1015         if (adc_mode == ADC12_INT_SELECT) { // Wenn der 12 Bit ADC verwendet wurde, sind die Daten Codiert
1016             for (packages_counter=0; packages_counter < burst_frame_lenght; packages_counter++) {
1017
1018                 packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1019                     sample_counter] >> 12) & 0x0F);
1019                 packages_counter++;

```

```

1020
1021         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1022             sample_counter] >> 4) & 0xFF);
1023         packages_counter++;
1024         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1025             sample_counter] << 0) & 0x0F);
1026         packages_counter++;
1027         sample_counter++;
1028         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1029             sample_counter] >> 8) & 0xFF);
1030         packages_counter++;
1031         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1032             sample_counter] >> 4) & 0x0F);
1033         packages_counter++;
1034         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1035             sample_counter] << 4) & 0xF0);
1036         sample_counter++;
1037         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] |= (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1038             sample_counter] >> 12) & 0x0F);
1039         packages_counter++;
1040         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(18))+
1041             sample_counter] >> 8) & 0xFF);
1042         packages_counter++;
1043         sample_counter++;
1044     }
1045 } else if (AD7691_EXT_SELECT) {
1046     for(packages_counter=0;packages_counter < burst_frame_lenght;packages_counter++) {
1047         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(
1048             burst_frame_lenght/2))+sample_counter] >> 8) & 0xFF);
1049         seq_number++; // Sequenznummer hochzählen
1050         packages_counter++;
1051         packet[HEADER_LENGTH + packages_counter] = (uint8_t)((sample_burst_buf[(frame_number*(
1052             burst_frame_lenght/2))+sample_counter] >> 0) & 0xFF);
1053         seq_number++; // Sequenznummer hochzählen
1054         sample_counter++;
1055     }
1056 }
1057 cc430_tx((HEADER_LENGTH + burst_frame_lenght), packet);
1058 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
1059 } break;
1060
1061 /******
1062 ** Kommando zur Takt Kalibrierung
1063 *****/
1064 case COMMAND_CALI_CLK: {
1065
1066     // uint32_t dco_value = 480;
1067
1068     AD7691_CNV_SET_LOW; // Testpin
1069
1070     do{
1071         if (rx_command == COMMAND_CLK_UP)
1072             dco_value++;
1073         else if (rx_command == COMMAND_CLK_DOWN)
1074             dco_value--;
1075         else if (rx_command == COMMAND_CALI_BURST)
1076             dco_value = dco_value;
1077
1078     }
1079
1080     /*** BEGIN DCO auf neuen Wert setzen *****/
1081     __bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL control loop
1082     UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
1083     UCSCTL1 = DCORSEL_7; // Select DCO range 24MHz operation
1084     UCSCTL2 = FLLD_1 + dco_value; // Set DCO Multiplier for 12MHz
1085     // (N + 1) * FLLRef = Fdco
1086     // (487 + 1) * 32768 = 16MHz
1087     // Set FLL Div = fDCOCLK/2
1088     __bic_SR_register(SCG0); // Enable the FLL control loop
1089
1090     __delay_cycles(500000);
1091     /*** END DCO auf neuen Wert setzen *****/
1092
1093     /*** Grundeinstellungen *****/
1094

```

```

1095 // GDO0 ist Output und GDO2 ist Input
1096 CC430_GDO2_DIR_IN;
1097 CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
1098 CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
1099 CC430_GDO2_IRQ_FALLING_EDGE;
1100
1101 CC430_GDO0_SET_HIGH;
1102 //*****
1103
1104 //*** Takt synchronisierung *****
1105 cc430_reset(); // Reset all registers to their default values and go to idle
           state
1106
1107 PMMCTL0_H = 0xA5; // Get write-access to port mapping regs
1108 PMMCTL0_L |= PMMHPMRE_L;
1109 PMMCTL0_H = 0x00; // Lock Port mapping
1110
1111 cc430_config_cali(); // Configure the transceiver for sending the wakeup signal
1112
1113 timer_b_init_clock_cali();
1114
1115 //*****
1116 // Map the timer to Port P2.2 (thats only for debuging)
1117 // Init P2.2 to output TX signal from the radio
1118 P2SEL |= BIT3;
1119 P2DIR |= BIT3;
1120 PMAPPWD = 0x02D52; // Get write-access to port mapping regs
1121 P2MAP3 = PM_TA1CCR0A; // Map TA output to TX to P2.2
1122 PMAPPWD = 0x00; // Lock Port mapping
1123 //*****
1124
1125 cc430_burst_tx();
1126 AD7691_CNV_SET_HIGH; // Testpin
1127 while (clk_cali_counter < 300);
1128 AD7691_CNV_SET_LOW; // Testpin
1129 clk_cali_counter = 0;
1130 TIMER_A_STOP;
1131
1132 //*** BEGIN DCO wieder auf 1MHz setzen *****
1133 clk_set = 1; //CLK ist auf 1MHz gesetzt
1134 __bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL control loop
1135 UCSCCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
1136 UCSCCTL1 = DCORSEL_3; // Select DCO range 16MHz operation
1137 UCSCCTL2 = FLLD_1 + DCO_MP_1MHZ; // Set DCO Multiplier for 8MHz
           // (N + 1) * FLLRef = Fdco
           // (249 + 1) * 32768 = 8MHz
1138 // Set FLL Div = fDCOCLK/2
1139 // Enable the FLL control loop
1140 __bic_SR_register(SCG0);
1141
1142 __delay_cycles(31250);
1143 //*** END DCO wieder auf 1MHz setzen *****
1144
1145 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length); // Get in RX mode
1146
1147 command_recived = 0; // Reset the RX flag
1148 while (!command_recived); // Wait until a command is received
1149
1150 command_recived = 0; // Reset the RX flag
1151 } while (rx_command != COMMAND_CLK_OK); // Check if the CLK is ok
1152 //*****
1153
1154 cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
1155 command_recived = 0;
1156 } break;
1157
1158
1159 //*****
1160 ** Kommando zur Laufzeitermittlung
1161 //*****
1162 case COMMAND_CALI_BURST: {
1163
1164     clk_init_MHz(16); // DCO auf 16 MHz setzen
1165     clk_set = 16; // CLK ist auf 16MHz gesetzt
1166     uint16_t time_adc = 0;
1167
1168     AD7691_CNV_SET_LOW;
1169     timer_a_test();
1170     //*** Grundeinstellungen *****
1171     // GDO0 ist Output und GDO2 ist Input
1172     CC430_GDO2_DIR_IN;
1173     CC430_GDO2_IRQ_DISABLE;
1174     CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
1175     CC430_GDO2_IRQ_FALLING_EDGE; // IRQ is trigger on a rising egde
1176
1177     CC430_GDO0_ACCESS; // Get access to the GDO0 PIN
1178     CC430_GDO0_SET_HIGH; // Set GDO0 pin high

```

```

1179         /*** Grundeinstellungen *****/
1180
1181         // cc430_init_burst();           // Auf Empfang konfigurieren
1182         cc430_reset();                 // cc430 reset
1183         cc430_config_cali_burst();
1184         cc430_burst_rx();             // Ab hier wird empfangen
1185         IRQ_SET_CALI_BURST;           // IRQ auf Burst Mode stellen
1186         BURST_CALL_FLAG_UNSET;
1187         delay_ms(1);
1188         // Interrupt freischalten
1189         CC430_GDO2_IRQ_CLEAR;
1190         CC430_GDO2_IRQ_ENABLE;
1191
1192         // Ab hier wird Interruptgesteuert empfangen
1193         while (BURST_CALL_FLAG_IS_UNSET);
1194
1195         /***/
1196         // cc430_reset();               // Reset chip and go to idle state
1197         // cc430_config_cali_burst();
1198         CC430_GDO0_SET_HIGH;           // Set GDO0 pin high
1199         Strobe(RF_SIDLE);
1200         Strobe(RF_STX);
1201         delay_ms(2);
1202         AD7691_CNV_SET_LOW;           // Testpin
1203         Strobe(RF_SIDLE);
1204
1205         time_adc = TA0R;
1206         TIMER_B_STOP;
1207
1208         clk_init_MHz(1);               // DCO auf 16 MHz setzen
1209         clk_set = 1;                  // CLK ist auf 16MHz gesetzt
1210
1211         delay_ms(50);
1212
1213         packet[0] = ADDRESS_BASE_STATION;
1214         packet[1] = ADDRESS_THIS_SENSOR;
1215         packet[2] = (time_adc >> 8) & 0xFF;
1216         packet[3] = (time_adc >> 0) & 0xFF;
1217
1218         packet[4] = (time_adc >> 8) & 0xFF;
1219         packet[5] = (time_adc >> 0) & 0xFF;
1220
1221         cc430_tx(6, packet);
1222
1223         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
1224         command_recived = 0;
1225
1226     } break;
1227
1228     /***/
1229     ** Kommando SLEEP empfangen
1230     *****/
1231     case COMMAND_DOWNLINK_SLEEP: {
1232
1233         led_on(LED_ALL);
1234         delay_ms(1000);
1235         led_off(LED_ALL);
1236
1237         init_for_sleep();
1238
1239         ENTER_LPM4;
1240
1241     } break;
1242
1243     /***/
1244     **
1245     *****/
1246     case COMMAND_WAIT: {
1247
1248         cc430_rx(HEADER_LENGTH + rx_data_length);
1249     } break;
1250 }
1251 }
1252 }
1253 }
1254 }

```

```

1  /*****
2  **   Description   : spi.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 22/11/2014
5  **   Last Update : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10
11 void init_spi(void) {
12     UCA0CTL1 |= UCSWRST;           // **Put state machine in reset**
13
14     UCA0CTL0 |= UCMST;             // Sync. Mode: Master Select
15     UCA0CTL0 |= UCSYNC;           // Sync-Mode 0:UART-Mode / 1:SPI-Mode
16     UCA0CTL0 &= ~UCCKPL;         // Sync. Mode: Clock Polarity
17     UCA0CTL0 &= ~UCCKPH;         // Sync. Mode: Clock Polarity
18     UCA0CTL0 |= UCMSB;           // Async. Mode: MSB first 0:LSB / 1:MSB
19
20     UCA0CTL1 |= (UCSSEL1 | UCSSEL0);
21     UCA0BR0 = 8;                 // /2
22     UCA0BR1 = 0;                 //
23
24     UCA0MCTL = 0;                // No modulation
25
26     // Config the SPI functionality
27     SPI_PxSEL |= SPI_CLK_PIN;
28     SPI_PxSEL |= SPI_MOSI_PIN;
29
30     SPI_PxSEL |= SPI_MISO_PIN;
31     SPI_PxDIR |= SPI_CLK_PIN;    // Define CLK as outputs
32     SPI_PxDIR |= SPI_MOSI_PIN;   // Define MOSI as outputs
33     SPI_PxDIR &= ~SPI_MISO_PIN;  // MISO is input
34
35     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;        // **Initialize USCI state machine**
36 }
37
38
39 void spi_write_register(uint8_t address, uint8_t reg, uint8_t value) {
40     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX to finish
41     UCA0TXBUF = address | reg;    // Send address and register
42     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX to finish
43     UCA0TXBUF = 0x00;            // Write dummy Byte
44     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX complete
45     UCA0TXBUF = value;           // Send value
46     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX complete
47 }
48
49
50
51 char spi_read_register(uint8_t address, uint8_t reg) {
52     uint8_t value;
53
54     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX to finish
55     UCA0TXBUF = address | reg;    // Send address and register
56     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX to finish
57     UCA0TXBUF = 0x00;            // Write dummy Byte
58     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX complete
59     UCA0TXBUF = 0x00;            // Write dummy Byte
60     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX complete
61     value = UCA0RXBUF;           // Read data from buffer
62
63     return value;                // Return the value
64 }
65
66 void spi_send_command(uint8_t command, uint8_t reg) {
67     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX to finish
68     UCA0TXBUF = command | reg;    // Send configuration mode and register
69     while (UCA0STAT & UCIBUSY);  // Wait for TX to finish
70 }
71
72 }

```



```

1  /*****
2  **   Description   : temp_sensor.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 07/03/2013
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header/main.h"
10
11 extern uint16_t config_value;
12
13 void temp_sensor_init(void) {
14     i2c_init();
15     temp_sensor_get_contr_reg();
16 }
17
18 void temp_sensor_get_contr_reg() {
19     uint8_t data[2];
20
21     /*****
22     * Pointer wird auf das Config Register ausgerichtet
23     *****/
24     data[0] = TMP102_REG_CONF; // Value for Pointer-Register
25
26     i2c_write(ADDR_TMP102, 1, data); // Set Pointer-Register
27
28     i2c_read(ADDR_TMP102, 2, data); // Read Control-Register
29
30     config_value = (uint16_t) data[0] << 4;
31     config_value |= data[1] >> 4;
32 }
33
34 void temp_sensor_config_reg() {
35     uint8_t data[3];
36
37     /*****
38     * Hier wird der Temperatursensor konfiguriert
39     *****/
40     TMP102_EM_OFF;
41     TMP102_CON_RATE_4;
42     TMP102_SD_OFF;
43     TMP102_COMPERATOR_MODE;
44     TMP102_POL_INV;
45     TMP102_FAULTS_6;
46
47     data[0] = TMP102_REG_CONF; // Value for Pointer-Register
48     data[1] = (uint8_t) (config_value >> 8); // Byte 1 at first
49     data[2] = (uint8_t) (config_value & 0x00FF); // Byte 2 at last
50
51     i2c_write(ADDR_TMP102, 3, data); // Write Control-Register
52 }
53
54 /*****
55 ** Setzen der Alarmtemperatur
56 ** 1 Digit -> 0.0625°C
57 ** 0x1900 -> 25°C
58 *****/
59 void temp_sensor_set_alert(uint16_t temp_low, uint16_t temp_high) {
60     uint8_t data[3];
61
62     /*****
63     * Low Daten setzen
64     *****/
65     data[0] = TMP102_REG_LOW; // Value for Pointer-Register
66     data[1] = (uint8_t) (temp_low >> 8); // Byte 1 at first
67     data[2] = (uint8_t) (temp_low & 0x00FF); // Byte 2 at last
68
69     i2c_write(ADDR_TMP102, 3, data); // Write Control-Register
70
71     /*****
72     * High Daten setzen
73     *****/
74     data[0] = TMP102_REG_HIGH; // Value for Pointer-Register
75     data[1] = (uint8_t) (temp_high >> 8); // Byte 1 at first
76     data[2] = (uint8_t) (temp_high & 0x00FF); // Byte 2 at last
77
78     i2c_write(ADDR_TMP102, 3, data); // Write Control-Register
79 }
80
81 uint16_t temp_sensor_get_temp(void) {
82
83     uint8_t data[2];
84     uint16_t temp_value = 0x0000;
85

```

```
86     data[0] = TMP102_REG_TEMP;                // Value for Pointer-Register
87     i2c_write(ADDR_TMP102, 1, data);          // Set Pointer-Register
88     temp_value = 0x0000;
89     i2c_read(ADDR_TMP102, 2, data);
90
91     temp_value = (uint16_t) data[0] << 4;
92     temp_value |= data[1] >> 4;
93
94     return temp_value;
95 }
```

```

1  /*****
2  **   Description   : timer.c
3  **   Hardware     : BATSEN ZS 3 v0.5
4  **   Date        : 13/03/2013
5  **   Last Update  : 02/08/2015
6  **   Author      : Nico Sassano
7  **   State       : Final state
8  *****/
9  #include "header\main.h"
10
11 extern volatile uint8_t irq_timera;           // Status TimerA
12 extern volatile uint8_t irq_timerb;         // Status TimerB
13 extern volatile uint8_t burst_error_flag;
14 extern volatile uint8_t adc_select;
15 extern volatile uint8_t clk_set;
16 extern volatile uint16_t delay_counter;
17
18 /*****
19 ** Timer A Initialisierung für die Balancierung
20 ** 1MHz; DIV=8; TACCR0 = 62500 -> 500ms
21 *****/
22 void timer_a_init_balanc(void) {
23     IRQ_TIMER_A_SET_BALANCING;
24     TIMER_A_STOP;
25     TIMER_A_RESET;
26     TIMER_A_SOURCE_SMCLK;
27     TIMER_A_SOURCE_DIV_8;
28
29     TACCR0 = 62500;
30     TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
31 }
32
33 /*****
34 ** Timer A TEST TIMER
35 ** 1MHz; DIV=8; TACCR0 = 62500 -> 500ms
36 *****/
37 void timer_a_test(void) {
38     TIMER_A_STOP;
39     TIMER_A_RESET;
40     TIMER_A_SOURCE_SMCLK;
41     TIMER_A_SOURCE_DIV_1;
42
43     TACCR0 = 62500;
44     TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
45 }
46
47 /*****
48 ** Timer B Initialisierung Trigger Abstandsmessung für die
49 ** Burstkalibrierung
50 ** 16MHz; DIV=1; TACCR0 = 65536 -> 4,096ms
51 *****/
52 void timer_b_init_cali(void) {
53     TIMER_B_STOP;
54     TIMER_B_RESET;
55
56     TIMER_B_SOURCE_SMCLK;
57     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
58     //TAR = 0;
59     //TACCR0 = 0x00;
60     //TIMER_A_0_CM_IRQ_ENABLE;
61 }
62
63 /*****
64 ** Timer A Initialisierung für die Taktkalibrierung
65 ** 16MHz; DIV=8; TACCR0 = 16000 -> 1ms
66 *****/
67 void timer_b_init_clock_cali(void) {
68     IRQ_TIMERB_SET_CLOCK_CALI;
69     TAICCR0 = 16000;
70     TAICCR2 = 16000;
71
72     TAICCTL0 = OUTMOD_4; /* PWM output mode: 4 - toggle */
73     TAICCTL1 = OUTMOD_4; /* PWM output mode: 4 - toggle */
74
75     TAICTL = TASSEL_SMCLK + MC_1 + TACLR;
76
77     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
78 }
79
80 /*****
81 ** Timer B
82 ** Initialisierung für die Burstmessung
83 *****/
84 void timer_b_init_burst(uint8_t freq) {
85

```

```
86     IRQ_TIMERB_SET_BURST;
87
88     TIMER_B_STOP;
89     TIMER_B_RESET;
90     TIMER_B_SOURCE_SMCLK;
91
92     switch(freq) {
93
94         /*****
95         ** 16MHz; TimerDiv 1
96         ** Periode -> 100us
97         ** 1472 (ISR)-> 92us
98         *****/
99         case BURST_FREQ_10000HZ: {
100             TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
101
102             if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
103                 TBCCR0 = 2000 - 1472; // 125us - 92us (ISR)
104             } else {
105                 TBCCR0 = 1600 - 184; // 100 us - 11,5us (ISR)
106                 BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
107             }
108
109             // Interrupts für TimerB freischalten
110             TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
111             TIMER_B_1_CM_IRQ_DISABLE;
112         }break;
113
114         /*****
115         ** 16MHz; TimerDiv 1
116         ** Periode -> 125us
117         ** 1472 (ISR) -> 92us
118         *****/
119         case BURST_FREQ_8000HZ: {
120             TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
121
122             if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
123                 TBCCR0 = 2400 - 1472; // 150us - 92us (ISR)
124             } else {
125                 TBCCR0 = 2000 - 184; // 125 us - 11,5us (ISR)
126                 BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
127             }
128
129             // Interrupts für TimerB freischalten
130             TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
131             TIMER_B_1_CM_IRQ_DISABLE;
132         }break;
133
134         /*****
135         ** 16MHz; TimerDiv 1
136         ** Periode -> 166us
137         ** 1472 (ISR)-> 92us
138         *****/
139         case BURST_FREQ_6000HZ: {
140             TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
141
142             if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
143                 TBCCR0 = 3200 - 1472; // 200 us - 92us (ISR)
144             } else {
145                 TBCCR0 = 2656 - 184; // 166 us - 11,5us (ISR)
146                 BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
147             }
148
149             // Interrupts für TimerB freischalten
150             TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
151             TIMER_B_1_CM_IRQ_DISABLE;
152         }break;
153
154         /*****
155         ** 16MHz; TimerDiv 1
156         ** Periode -> 250us
157         ** 1472 (ISR)-> 92us
158         *****/
159         case BURST_FREQ_4000HZ: {
160             TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
161
162             if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
163                 TBCCR0 = 4400 - 1472; // 275us - 92us (ISR)
164             } else {
165                 TBCCR0 = 4000 - 184; // 250 us - 11,5us (ISR)
166                 BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
167             }
168
169             // Interrupts für TimerB freischalten
170             TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
```

```
171     TIMER_B_1_CM_IRQ_DISABLE;
172 }break;
173
174 /*****
175 ** 16MHz; TimerDiv 1
176 ** Periode -> 500us
177 ** 1472 (ISR)-> 92us
178 *****/
179 case BURST_FREQ_2000HZ: {
180     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
181
182     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
183         TBCCR0 = 9600 - 1472; // 600us - 92us (ISR)
184     } else {
185         TBCCR0 = 8000 - 184; // 500 us - 11,5us (ISR)
186         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
187     }
188
189     // Interrupts für TimerB freischalten
190     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
191     TIMER_B_1_CM_IRQ_DISABLE;
192 }break;
193
194 /*****
195 ** 16MHz; TimerDiv 1
196 ** Periode -> 1ms
197 ** 12800 -> 800us
198 ** 19200 -> 1.2ms
199 ** 1472 (ISR)-> 92us
200 *****/
201 case BURST_FREQ_1000HZ: {
202     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
203
204     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
205         TBCCR1 = 12800 - 1472; // 800us - 92us (ISR)
206         TBCCR0 = 19200 - 1472; // 1200us - 92us (ISR)
207     } else {
208         TBCCR1 = 8600 ; // 600 us
209         TBCCR0 = 16000; // 1000 us
210         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
211     }
212
213     // Interrupts für TimerB freischalten
214     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
215     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
216
217 }break;
218
219 /*****
220 ** 16MHz; TimerDiv 1
221 ** Periode -> 1,052ms
222 ** 13632 -> 0.852 ms
223 ** 20032 -> 1.252 ms
224 ** 1472 (ISR)-> 92us
225 *****/
226 case BURST_FREQ_950HZ: {
227     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
228     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
229         TBCCR1 = 13632 - 1472; // 0.852 ms - 33 us
230         TBCCR0 = 20032 - 1472; // 1.252 ms - 33 us
231     } else {
232         TBCCR1 = 10432; // 652 us
233         TBCCR0 = 16832; // 1052 us
234         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
235     }
236
237     // Interrupts für TimerB freischalten
238     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
239     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
240 }break;
241
242 /*****
243 ** 16MHz; TimerDiv 1
244 ** Periode -> 1.10 ms
245 ** 14400 -> 0.90 ms
246 ** 20800 -> 1.30 ms
247 ** 1472 (ISR)-> 92us
248 *****/
249 case BURST_FREQ_900HZ: {
250     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
251     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
252         TBCCR1 = 14400 - 1472;
253         TBCCR0 = 20800 - 1472;
254     } else {
255         TBCCR1 = 11200; // 700 us
```

```

256         TBCCR0 = 17600;           // 1.1 ms
257         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
258     }
259
260     // Interrupts für TimerB freischalten
261     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
262     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
263 }break;
264
265 /*****
266 ** 16MHz; TimerDiv 1
267 ** Periode -> 1.176 ms
268 ** 15616 -> 0.976 ms
269 ** 22016 -> 1.376 ms
270 ** 1472 (ISR)-> 92us
271 *****/
272 case BURST_FREQ_850HZ: {
273     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
274     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
275         TBCCR1 = 15616 - 1472;
276         TBCCR0 = 22016 - 1472;
277     } else {
278         TBCCR1 = 12416;           // 0.776 ms
279         TBCCR0 = 18816;           // 1.176 ms
280         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
281     }
282
283     // Interrupts für TimerB freischalten
284     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
285     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
286 }break;
287
288 /*****
289 ** 16MHz; TimerDiv 1
290 ** Periode -> 1.25 ms
291 ** 16800 -> 1.05 ms
292 ** 23200 -> 1.45 ms
293 ** 1472 (ISR)-> 92us
294 *****/
295 case BURST_FREQ_800HZ: {
296     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
297     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
298         TBCCR1 = 16800 - 1472;
299         TBCCR0 = 23200 - 1472;
300     } else {
301         TBCCR1 = 13600;           // 850us
302         TBCCR0 = 20000;           // 1.25 ms
303         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
304     }
305
306     // Interrupts für TimerB freischalten
307     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
308     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
309 }break;
310
311 /*****
312 ** 16MHz; TimerDiv 1
313 ** Periode -> 1.33 ms
314 ** 18080 -> 1.13 ms
315 ** 24480 -> 1.53 ms
316 ** 1472 (ISR)-> 92us
317 *****/
318 case BURST_FREQ_750HZ: {
319     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
320     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
321         TBCCR1 = 18080 - 1472;
322         TBCCR0 = 24480 - 1472;
323     } else {
324         TBCCR1 = 14880;           // 0.930 ms
325         TBCCR0 = 21280;           // 1.330 ms
326         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
327     }
328
329     // Interrupts für TimerB freischalten
330     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
331     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
332 }break;
333
334 /*****
335 ** 16MHz; TimerDiv 1
336 ** Periode -> 1.49 ms
337 ** 20640 -> 1.29 ms
338 ** 27040 -> 1.69 ms
339 ** 1472 (ISR)-> 92us
340 *****/

```

```
341     case BURST_FREQ_700HZ: {
342         TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
343         if (BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
344             TBCCR1 = 20640 - 1472;
345             TBCCR0 = 27040 - 1472;
346         } else {
347             TBCCR1 = 17440;           // 1.09 ms
348             TBCCR0 = 23840;           // 1.49 ms
349             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
350         }
351
352         // Interrupts für TimerB freischalten
353         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
354         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
355     } break;
356
357     /*****
358     ** 16MHz; TimerDiv 1
359     ** Periode -> 1.54 ms
360     ** 21440 -> 1.34 ms
361     ** 27840 -> 1.74 ms
362     ** 1472 (ISR)-> 92us
363     *****/
364     case BURST_FREQ_650HZ: {
365         TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
366
367         if (BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
368             TBCCR1 = 21440 - 1472;
369             TBCCR0 = 27840 - 1472;
370         } else {
371             TBCCR1 = 18240;           // 1.14 ms
372             TBCCR0 = 24640;           // 1.54 ms
373             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
374         }
375
376         // Interrupts für TimerB freischalten
377         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
378         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
379     } break;
380
381     /*****
382     ** 16MHz; TimerDiv 1
383     ** Periode -> 1.60 ms
384     ** 22400 -> 1.40 ms
385     ** 28800 -> 1.80 ms
386     ** 1472 (ISR)-> 92us
387     *****/
388     case BURST_FREQ_600HZ: {
389         TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
390
391         if (BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
392             TBCCR1 = 22400 - 1472;
393             TBCCR0 = 28800 - 1472;
394         } else {
395             TBCCR1 = 19200;           // 1.2 ms
396             TBCCR0 = 25600;           // 1.6 ms
397             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
398         }
399
400         // Interrupts für TimerB freischalten
401         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
402         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
403     } break;
404
405     /*****
406     ** 16MHz; TimerDiv 1
407     ** Periode -> 1.80 ms
408     ** 25600 -> 1.60 ms
409     ** 32000 -> 2.00 ms
410     ** 1472 (ISR)-> 92us
411     *****/
412     case BURST_FREQ_550HZ: {
413         TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
414
415         if (BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
416             TBCCR1 = 25600 - 1472;
417             TBCCR0 = 32000 - 1472;
418         } else {
419             TBCCR1 = 22400;           // 1.4 ms
420             TBCCR0 = 28800;           // 1.8 ms
421             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
422         }
423
424         // Interrupts für TimerB freischalten
425         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
```

```
426     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
427 }break;
428
429 /*****
430 ** 16MHz; TimerDiv 1
431 ** Periode -> 2.00 ms
432 ** 28800 -> 1.80 ms
433 ** 35200 -> 2.20 ms
434 ** 1472 (ISR)-> 92us
435 *****/
436 case BURST_FREQ_500HZ: {
437     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
438
439     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
440         TBCCR1 = 28800 - 1472;
441         TBCCR0 = 35200 - 1472;
442     } else {
443         TBCCR1 = 25600;           // 1.6 ms
444         TBCCR0 = 32000;         // 2.0 ms
445         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
446     }
447
448     // Interrupts für TimerB freischalten
449     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
450     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
451 }break;
452
453 /*****
454 ** 16MHz; TimerDiv 1
455 ** Periode -> 2.22 ms
456 ** 32320 -> 2.02 ms
457 ** 38720 -> 2.42 ms
458 ** 1472 (ISR)-> 92us
459 *****/
460 case BURST_FREQ_450HZ: {
461     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
462
463     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
464         TBCCR1 = 32320 - 1472;
465         TBCCR0 = 38720 - 1472;
466     } else {
467         TBCCR1 = 29120;           // 1.82 ms
468         TBCCR0 = 35520;         // 2.22 ms
469         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
470     }
471
472     // Interrupts für TimerB freischalten
473     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
474     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
475 }break;
476
477 /*****
478 ** 16MHz; TimerDiv 1
479 ** Periode -> 2.50 ms
480 ** 36800 -> 2.30 ms
481 ** 43200 -> 2.00 ms
482 ** 1472 (ISR)-> 92us
483 *****/
484 case BURST_FREQ_400HZ: {
485     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
486
487     if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
488         TBCCR1 = 36800 - 1472;
489         TBCCR0 = 43200 - 1472;
490     } else {
491         TBCCR1 = 33600;           // 2.1 ms
492         TBCCR0 = 40000;         // 2.5 ms
493         BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
494     }
495
496     // Interrupts für TimerB freischalten
497     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
498     TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
499 }break;
500
501 /*****
502 ** 16MHz; TimerDiv 1
503 ** Periode -> 2.85 ms
504 ** 42400 -> 2.65 ms
505 ** 48800 -> 3.05 ms
506 ** 1472 (ISR)-> 92us
507 *****/
508 case BURST_FREQ_350HZ: {
509     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
510
```



```
511         if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
512             TBCCR1 = 42400 - 1472;
513             TBCCR0 = 48800 - 1472;
514         } else {
515             TBCCR1 = 39200;           // 2.45 ms
516             TBCCR0 = 45600;           // 2.85 ms
517             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
518         }
519
520         // Interrupts für TimerB freischalten
521         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
522         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
523     }break;
524
525     /*****
526     ** 16MHz; TimerDiv 1
527     ** Periode -> 3.33 ms
528     ** 50080 -> 3.13 ms
529     ** 56480 -> 3.53 ms
530     ** 1472 (ISR)-> 92us
531     *****/
532     case BURST_FREQ_300HZ: {
533         TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
534
535         if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
536             TBCCR1 = 50080 - 1472;
537             TBCCR0 = 56480 - 1472;
538         } else {
539             TBCCR1 = 46880;           // 2.93 ms
540             TBCCR0 = 53280;           // 3.33 ms
541             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
542         }
543
544         // Interrupts für TimerB freischalten
545         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
546         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
547     }break;
548
549     /*****
550     ** 16MHz; TimerDiv 2
551     ** Periode -> 4.00 ms
552     ** 30400 -> 3.80 ms
553     ** 33600 -> 4.20 ms
554     ** 264 (ISR)-> 92us
555     *****/
556     case BURST_FREQ_250HZ: {
557         TIMER_B_SOURCE_DIV_2;
558
559         if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
560             TBCCR1 = 30400 - 264;
561             TBCCR0 = 33600 - 264;
562         } else {
563             TBCCR1 = 28800;           // 3.6 ms
564             TBCCR0 = 32800;           // 4.1 ms
565             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
566         }
567
568         // Interrupts für TimerB freischalten
569         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
570         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
571     }break;
572
573     /*****
574     ** 16MHz; TimerDiv 2
575     ** Periode -> 5.00 ms
576     ** 38400 -> 4.80 ms
577     ** 41600 -> 5.20 ms
578     ** 264 (ISR)-> 92us
579     *****/
580     case BURST_FREQ_200HZ: {
581         TIMER_B_SOURCE_DIV_2;
582
583         if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
584             TBCCR1 = 38400 - 264;
585             TBCCR0 = 41600 - 264;
586         } else {
587             TBCCR1 = 36800;           // 4.6 ms
588             TBCCR0 = 40000;           // 5.0 ms
589             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
590         }
591
592         // Interrupts für TimerB freischalten
593         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
594         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
595     }break;
```

```

596
597
598     /**
599     ** 16MHz; TimerDiv 2
600     ** Periode -> 6.66 ms
601     ** 51680 -> 6.46 ms
602     ** 54880 -> 6.86 ms
603     ** 264 (ISR)-> 92us
604     *****/
605     case BURST_FREQ_150HZ: {
606         TIMER_B_SOURCE_DIV_2;
607
608         if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
609             TBCCR1 = 51680 - 264;
610             TBCCR0 = 54880 - 264;
611
612         } else {
613             TBCCR1 = 50080;           // 6.26 ms
614             TBCCR0 = 53280;           // 6.66 ms
615             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
616         }
617
618         // Interrupts für TimerB freischalten
619         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
620         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
621     }break;
622
623     /**
624     ** 16MHz; TimerDiv 4
625     ** Periode -> 10.0 ms
626     ** 39200 -> 9.80 ms
627     ** 40800 -> 10.2 ms
628     ** 132 (ISR)-> 92us //TODO NACH MEINER RECHNUNG 368 fuer 92us wohin ist der rest?
629     ** 6534 (ISR AD24) -> 4.553ms
630     *****/
631     case BURST_FREQ_100HZ: {
632         TIMER_B_SOURCE_DIV_4;
633
634         if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert
635             TBCCR1 = 39200 - 132;
636             TBCCR0 = 40800 - 132;
637
638         } else {
639             TBCCR1 = 38400;           // 9.6 ms
640             TBCCR0 = 40025;           // 10.0 ms
641
642             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
643         }
644
645         // Interrupts für TimerB freischalten
646         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
647         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
648     }break;
649
650     /**
651     ** 16MHz; TimerDiv 8
652     ** Periode -> 20.0 ms
653     ** 39600 -> 19.8 ms
654     ** 40400 -> 20.2 ms
655     ** 66 (ISR) -> 92us
656     *****/
657     case BURST_FREQ_50HZ: {
658         TIMER_B_SOURCE_DIV_8;
659
660         if(BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET) { // Wurde ein Fehler dedektiert?
661             TBCCR1 = 39600 - 66;
662             TBCCR0 = 40400 - 66;
663
664         } else {
665             TBCCR1 = 39200;           // 19.6 ms
666             TBCCR0 = 40000;           // 20.0 ms
667             BURST_ERROR_FLAG_UNSET;
668         }
669
670         // Interrupts für TimerB freischalten
671         TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
672         TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE;
673     }break;
674 }
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

```
681     IRQ_TIMERB_SET_DELAY;
682     TIMER_B_STOP;
683     TIMER_B_RESET;
684     TIMER_B_SOURCE_SMCLK;
685     TIMER_B_SOURCE_DIV_1;
686
687     switch (clk_set) {
688     case 1:
689         TBCCR0 = 1000;
690         break;
691
692     case 12:
693         TBCCR0 = 12000;
694
695     case 16:
696         TBCCR0 = 16000;
697
698     default: break;
699     }
700
701     TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE;
702     TIMER_B_START_UP_MODE;
703
704     // Wait until the delay time is over
705     while (delay_counter < ms);
706
707     TIMER_B_STOP;
708     IRQ_TIMERB_UNSET_DELAY;
709 }
```



```

41 #define ADC12_SHT1_CLK_384      (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT02 | ADC12SHT01)); \
42                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT00));
43 #define ADC12_SHT1_CLK_512      (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT02 | ADC12SHT00)); \
44                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT01));
45 #define ADC12_SHT1_CLK_768      (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT02)); \
46                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT01 | ADC12SHT00));
47 #define ADC12_SHT1_CLK_1024     (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT01 | ADC12SHT00)); \
48                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT02));
49
50 /*****
51 ** Sample-and-hold time for registers ADC12MEM0 to ADC12MEM7
52 *****/
53 #define ADC12_SHT0_CLK_4         (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03 | ADC12SHT02 | ADC12SHT01 | ADC12SHT00));
54 #define ADC12_SHT0_CLK_8         (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03 | ADC12SHT02 | ADC12SHT01)); \
55                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT00));
56 #define ADC12_SHT0_CLK_16        (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03 | ADC12SHT02 | ADC12SHT00)); \
57                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT01));
58 #define ADC12_SHT0_CLK_32        (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03 | ADC12SHT02)); \
59                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT01 | ADC12SHT00));
60 #define ADC12_SHT0_CLK_64        (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03 | ADC12SHT01 | ADC12SHT00)); \
61                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT02));
62 #define ADC12_SHT0_CLK_96        (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03 | ADC12SHT01)); \
63                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT02 | ADC12SHT00));
64 #define ADC12_SHT0_CLK_128       (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03 | ADC12SHT00)); \
65                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT02 | ADC12SHT01));
66 #define ADC12_SHT0_CLK_192       (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT03)); \
67                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT02 | ADC12SHT01 | ADC12SHT00));
68 #define ADC12_SHT0_CLK_256       (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT02 | ADC12SHT01 | ADC12SHT00)); \
69                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03));
70 #define ADC12_SHT0_CLK_384       (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT02 | ADC12SHT01)); \
71                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT00));
72 #define ADC12_SHT0_CLK_512       (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT02 | ADC12SHT00)); \
73                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT01));
74 #define ADC12_SHT0_CLK_768       (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT02)); \
75                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT01 | ADC12SHT00));
76 #define ADC12_SHT0_CLK_1024      (ADC12CTL0 &=~(ADC12SHT01 | ADC12SHT00)); \
77                               (ADC12CTL0 |= (ADC12SHT03 | ADC12SHT02));
78
79 /*****
80 ** Reference generator voltage
81 *****/
82 #define ADC12_REF_SET_1_5V       (ADC12CTL0 &=~REF2_5V)
83 #define ADC12_REF_SET_2_5V       (ADC12CTL0 |= REF2_5V)
84
85 /*****
86 ** Reference generator on/off
87 *****/
88 #define ADC12_SET_REF_OFF        (ADC12CTL0 &=~REFON)
89 #define ADC12_SET_REF_ON        (ADC12CTL0 |= REFON)
90
91 /*****
92 ** ADC12 on/off
93 *****/
94 #define ADC12_SET_OFF            (ADC12CTL0 &=~ADC12ON)
95 #define ADC12_SET_ON            (ADC12CTL0 |= ADC12ON)
96
97 /*****
98 ** ADC12 clock divider
99 *****/
100 #define ADC12DIV_SET_1           (ADC12CTL1 &=~(ADC12DIV2 | ADC12DIV1 | ADC12DIV0))
101 #define ADC12DIV_SET_2           (ADC12CTL1 &=~(ADC12DIV2 | ADC12DIV1)); \
102                               (ADC12CTL1 |= (ADC12DIV0));
103 #define ADC12DIV_SET_3           (ADC12CTL1 &=~(ADC12DIV2 | ADC12DIV0)); \
104                               (ADC12CTL1 |= (ADC12DIV1));
105 #define ADC12DIV_SET_4           (ADC12CTL1 &=~(ADC12DIV2)); \
106                               (ADC12CTL1 |= (ADC12DIV1 | ADC12DIV0));
107 #define ADC12DIV_SET_5           (ADC12CTL1 &=~(ADC12DIV1 | ADC12DIV0)); \
108                               (ADC12CTL1 |= (ADC12DIV2));
109 #define ADC12DIV_SET_6           (ADC12CTL1 &=~(ADC12DIV1)); \
110                               (ADC12CTL1 |= (ADC12DIV2 | ADC12DIV0));
111 #define ADC12DIV_SET_7           (ADC12CTL1 &=~(ADC12DIV0)); \
112                               (ADC12CTL1 |= (ADC12DIV2 | ADC12DIV1));
113 #define ADC12DIV_SET_8           (ADC12CTL1 |= (ADC12DIV2 | ADC12DIV1 | ADC12DIV0))
114
115 /*****
116 ** ADC12 clock source select
117 *****/
118 #define ADC12SSEL_SET_ADC12OSC   (ADC12CTL1 &=~(ADC12SSEL1 | ADC12SSEL0))
119 #define ADC12SSEL_SET_ACLK       (ADC12CTL1 &=~(ADC12SSEL1)); \
120                               (ADC12CTL1 |= (ADC12SSEL0));
121 #define ADC12SSEL_SET_MCLK       (ADC12CTL1 &=~(ADC12SSEL0)); \
122                               (ADC12CTL1 |= (ADC12SSEL1));
123 #define ADC12SSEL_SET_SCLK       (ADC12CTL1 |= (ADC12SSEL1 | ADC12SSEL0))
124
125 /*****

```

```

126 ** ADC12 Conversion start address
127 *****/
128 #define ADC12MEM_SET_0 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3 | CSTARTADD2 | CSTARTADD1 | CSTARTADD0))
129 #define ADC12MEM_SET_1 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3 | CSTARTADD2 | CSTARTADD1)); \
130 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD0))
131 #define ADC12MEM_SET_2 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3 | CSTARTADD2 | CSTARTADD0)); \
132 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD1))
133 #define ADC12MEM_SET_3 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3 | CSTARTADD2)); \
134 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD1 | CSTARTADD0))
135 #define ADC12MEM_SET_4 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3 | CSTARTADD1 | CSTARTADD0)); \
136 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD2))
137 #define ADC12MEM_SET_5 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3 | CSTARTADD1)); \
138 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD2 | CSTARTADD0))
139 #define ADC12MEM_SET_6 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3 | CSTARTADD0)); \
140 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD2 | CSTARTADD1))
141 #define ADC12MEM_SET_7 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD3)); \
142 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD2 | CSTARTADD1 | CSTARTADD0))
143 #define ADC12MEM_SET_8 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD2 | CSTARTADD1 | CSTARTADD0)); \
144 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3))
145 #define ADC12MEM_SET_9 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD2 | CSTARTADD1)); \
146 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3 | CSTARTADD0))
147 #define ADC12MEM_SET_10 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD2 | CSTARTADD0)); \
148 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3 | CSTARTADD1))
149 #define ADC12MEM_SET_11 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD2)); \
150 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3 | CSTARTADD1 | CSTARTADD0))
151
152 #define ADC12MEM_SET_12 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD1 | CSTARTADD0)); \
153 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3 | CSTARTADD2))
154 #define ADC12MEM_SET_13 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD1)); \
155 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3 | CSTARTADD2 | CSTARTADD0))
156 #define ADC12MEM_SET_14 (ADC12CTL1 &= ~(CSTARTADD0)); \
157 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3 | CSTARTADD2 | CSTARTADD1))
158 #define ADC12MEM_SET_15 (ADC12CTL1 |= (CSTARTADD3 | CSTARTADD2 | CSTARTADD1 | CSTARTADD0))
159
160
161 /*****
162 ** Conversion sequence mode select
163 ** CONSEQ0 -> Single-channel, single-conversion
164 ** CONSEQ1 -> Sequence-of-channels
165 ** CONSEQ2 -> Repeat-single-channel
166 ** CONSEQ3 -> Repeat-sequence-of-channels
167 *****/
168 #define ADC12_SET_CONSEQ0 (ADC12CTL1 &= ~(CONSEQ1 | CONSEQ0))
169 #define ADC12_SET_CONSEQ1 (ADC12CTL1 &= ~(CONSEQ1)); \
170 (ADC12CTL1 |= (CONSEQ0))
171 #define ADC12_SET_CONSEQ2 (ADC12CTL1 &= ~(CONSEQ0)); \
172 (ADC12CTL1 |= (CONSEQ1))
173 #define ADC12_SET_CONSEQ3 (ADC12CTL1 |= (CONSEQ1 | CONSEQ0))
174
175 /*****
176 ** Sample-and-hold pulse-mode select
177 ** SHP0 -> SAMPCON signal is sourced from the sample-input signal
178 ** SHP1 -> SAMPCON signal is sourced from the sampling timer
179 *****/
180 #define ADC12_SET_SHP0 (ADC12CTL1 &= ~(SHP))
181 #define ADC12_SET_SHP1 (ADC12CTL1 |= (SHP))
182
183 /*****
184 ** Select reference
185 ** REF0 -> VR+ = AVCC and VR- = AVSS
186 ** REF1 -> VR+ = VREF+ and VR- = AVSS
187 ** REF2 -> VR+ = VeREF+ and VR- = AVSS
188 ** REF3 -> VR+ = VeREF+ and VR- = AVSS
189 ** REF4 -> VR+ = AVCC and VR- = VREF-/ VeREF-
190 ** REF5 -> VR+ = VREF+ and VR- = VREF-/ VeREF-
191 ** REF6 -> VR+ = VeREF+ and VR- = VREF-/ VeREF-
192 ** REF7 -> VR+ = VeREF+ and VR- = VREF-/ VeREF-
193 *****/
194 #define ADC12_SET_REF0 (ADC12MCTL0 |= SREF_0)
195 #define ADC12_SET_REF1 (ADC12MCTL0 |= SREF_1)
196 #define ADC12_SET_REF2 (ADC12MCTL0 |= SREF_2)
197 #define ADC12_SET_REF3 (ADC12MCTL0 |= SREF_3)
198 #define ADC12_SET_REF4 (ADC12MCTL0 |= SREF_4)
199 #define ADC12_SET_REF5 (ADC12MCTL0 |= SREF_5)
200 #define ADC12_SET_REF6 (ADC12MCTL0 |= SREF_6)
201 #define ADC12_SET_REF7 (ADC12MCTL0 |= SREF_7)
202
203 /*****
204 ** Input channel select
205 **
206 *****/
207 #define ADC12_SET_INPUT_CH0 (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_0)
208 #define ADC12_SET_INPUT_CH1 (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_1)
209 #define ADC12_SET_INPUT_CH2 (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_2)
210 #define ADC12_SET_INPUT_CH3 (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_3)

```

```

211 #define ADC12_SET_INPUT_CH4      (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_4)
212 #define ADC12_SET_INPUT_CH5      (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_5)
213 #define ADC12_SET_INPUT_CH6      (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_6)
214 #define ADC12_SET_INPUT_CH7      (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_7)
215 #define ADC12_SET_TEMPERATUR      (ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_10)
216
217 /*-----
218     Public functions
219 -----*/
220
221 uint16_t adc12_get_volt_sample(uint8_t);
222 uint16_t adc12_get_temp_sample(uint8_t);
223 void adc12_init(void);
224 void adc12_volt_init(uint8_t, uint8_t);
225 void adc12_temp_init(uint8_t);
226 void adc12_disable(void);
227
228 #endif /* ADC12_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : adc12.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 11/22/2012
5  **   Last Update     : 03/08/2015
6  **   Author          : Phillip Durdaut and Nico Sassano
7  **   Description     : Header for the ADG918
8  *****/
9  #ifndef ADG918_H_
10 #define ADG918_H_
11 #include "main.h"
12
13 #define ADG918_CTRL_PxDIR ( P3DIR )
14 #define ADG918_CTRL_PxOUT ( P3OUT)
15 #define ADG918_CTRL_PIN ( BIT0 )
16
17 void adg918_init (void) ;
18 void adg918_wakeup (void);
19 void adg918_transceiver (void) ;
20 #endif /* ADG918_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : AS3930.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 10/09/2012
5  **   Last Update     : 09/06/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Header for the AS3930
8  *****/
9  #ifndef AS3930_H_
10 #define AS3930_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 #define AS3930_CS_PxDIR      P5DIR
15 #define AS3930_CS_PxOUT     P5OUT
16 #define AS3930_CS_PIN       BIT1
17
18 #define AS3930_SPI_PxSEL     P1SEL
19 #define AS3930_SPI_PxDIR    P1DIR
20 #define AS3930_SPI_PxIN     P1IN
21 #define AS3930_SPI_MOSI_PIN BIT6
22 #define AS3930_SPI_MISO_PIN BIT5
23 #define AS3930_SPI_CLK_PIN  BIT7
24 //
25 #define AS3930_WAKE_PxDIR    P2DIR
26 #define AS3930_WAKE_PxIES   P2IES
27 #define AS3930_WAKE_PxIE    P2IE
28 #define AS3930_WAKE_PxIFG   P2IFG
29 #define AS3930_WAKE_PIN     BIT5
30
31 #define AS3930_WAKE_DIR_IN   (AS3930_WAKE_PxDIR &= ~AS3930_WAKE_PIN)
32 #define AS3930_WAKE_IRQ_RISING_EDGE (AS3930_WAKE_PxIES &= ~AS3930_WAKE_PIN)
33 #define AS3930_WAKE_IRQ_FALLING_EDGE (AS3930_WAKE_PxIES |= AS3930_WAKE_PIN)
34 #define AS3930_WAKE_IRQ_ENABLE (AS3930_WAKE_PxIE |= AS3930_WAKE_PIN)
35 #define AS3930_WAKE_IRQ_DISABLE (AS3930_WAKE_PxIE &= ~AS3930_WAKE_PIN)
36 #define AS3930_WAKE_IRQ_PENDING ((AS3930_WAKE_PxIFG & AS3930_WAKE_PIN) == AS3930_WAKE_PIN)
37 #define AS3930_WAKE_CLEAR_IRQ (AS3930_WAKE_PxIFG &= ~(AS3930_WAKE_PIN))
38
39
40 void as3930_init(void);
41 void as3930_config_no_pattern(void);
42 void as3930_preset_default(void);
43 void as3930_clear_wakeup(void);
44 uint8_t as3930_get_rssi(void);
45

```

```

46 #endif /* AS3930_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : balancing.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 10/09/2013
5  **   Last Update     : 03/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Header for the passive balancing
8  *****/
9  #ifndef BALANCING_H_
10 #define BALANCING_H_
11 #include "main.h"
12
13 #define BALANCE_PORT_1_PxDIR    (P2DIR)
14 #define BALANCE_PORT_1_PxOUT   (P2OUT)
15 #define BALANCE_PORT_1_PIN     (BIT3)
16 #define BALANCE_PORT_2_PxDIR   (P3DIR)
17 #define BALANCE_PORT_2_PxOUT   (P3OUT)
18 #define BALANCE_PORT_2_PIN     (BIT5)
19
20 void balancing_init(void);
21 void balancing_on (void);
22 void balancing_off (void);
23 #endif /* BALANCING_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : cc430.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 24/09/2014
5  **   Last Update     : 09/06/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Header for the CC430
8  *****/
9  #ifndef cc430_H_
10 #define cc430_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 /*****
15 **   Defines for enabling the interrupts for a
16 **   associated signal on RFIEx
17 *****/
18 #define RFIE0    0x0001
19 #define RFIE1    0x0002
20 #define RFIE2    0x0004
21 #define RFIE3    0x0008
22 #define RFIE4    0x0010
23 #define RFIE5    0x0020
24 #define RFIE6    0x0040
25 #define RFIE7    0x0080
26 #define RFIE8    0x0100
27 #define RFIE9    0x0200
28 #define RFIE10   0x0400
29 #define RFIE11   0x0800
30 #define RFIE12   0x1000
31 #define RFIE13   0x2000
32 #define RFIE14   0x4000
33 #define RFIE15   0x8000
34
35 /*****
36 **   Defines for the interrupt edge select
37 **   Interrupt edge select bit RFIESx allows to trigger an interrupt on the positive edge (RFIES = 0)
38 **   or on the negative (RFIES = 1) edge of the associated signal.
39 *****/
40 #define RFIES0    0x0001
41 #define RFIES1    0x0002
42 #define RFIES2    0x0004
43 #define RFIES3    0x0008
44 #define RFIES4    0x0010
45 #define RFIES5    0x0020
46 #define RFIES6    0x0040
47 #define RFIES7    0x0080
48 #define RFIES8    0x0100
49 #define RFIES9    0x0200
50 #define RFIES10   0x0400
51 #define RFIES11   0x0800
52 #define RFIES12   0x1000
53 #define RFIES13   0x2000
54 #define RFIES14   0x4000
55 #define RFIES15   0x8000
56
57 /*****
58 **   Defines for detecting the interrupt pending
59 *****/

```



```

60 #define RFIFG0 0x0001
61 #define RFIFG1 0x0002
62 #define RFIFG2 0x0004
63 #define RFIFG3 0x0008
64 #define RFIFG4 0x0010
65 #define RFIFG5 0x0020
66 #define RFIFG6 0x0040
67 #define RFIFG7 0x0080
68 #define RFIFG8 0x0100
69 #define RFIFG9 0x0200
70 #define RFIFG10 0x0400
71 #define RFIFG11 0x0800
72 #define RFIFG12 0x1000
73 #define RFIFG13 0x2000
74 #define RFIFG14 0x4000
75 #define RFIFG15 0x8000
76 /** Debug ports *****/
77 * Here are the definitions for the GDOx debug ports
78 *****/
79 #define CC430_GDO0_PxDIR P1DIR
80 #define CC430_GDO0_PxOUT P1OUT
81 #define CC430_GDO0_PIN BIT6
82 #define CC430_GDO0_POS 6
83
84 #define CC430_GDO2_PxDIR P1DIR
85 #define CC430_GDO2_PxOUT P1OUT
86 #define CC430_GDO2_PIN BIT7
87 #define CC430_GDO2_POS 7
88
89 /** Write in the GDO0 register ****/
90 #define CC430_GDO0_ACCESS P1SEL |= BIT0
91 #define CC430_GDO0_SET_HIGH (WriteSingleReg(IOCFG0, 0x2D)); \
92 (gdo0_state = 0x01)
93
94 #define CC430_GDO0_SET_LOW (WriteSingleReg(IOCFG0, 0x2E)); \
95 (gdo0_state = 0x00)
96
97
98 #define IS_GDO0_STATE_LOW gdo0_state == 0x00
99 #define IS_GDO0_STATE_HIGH gdo0_state == 0x01
100 /** IRQ RFIES0 *****/
101 * RFIES0 based on the GDO0 on the CC1101 module
102 * This is the output on the asynchron mode
103 *****/
104 #define CC430_GDO0_IRQ_RISING_EDGE (RF1AIES &= ~RFIES0) // Positive edge
105 #define CC430_GDO0_IRQ_FALLING_EDGE (RF1AIES |= RFIES0) // Negative edge
106 #define CC430_GDO0_IRQ_ENABLE (RF1AIE |= RFIES0)
107 #define CC430_GDO0_IRQ_DISABLE (RF1AIE &= ~RFIES0)
108 #define CC430_GDO0_IRQ_PENDING ((RF1AIFG & RFIES0) == RFIES0)
109 #define CC430_GDO0_IRQ_CLEAR (RF1AIFG &= ~(RFIES0))
110 /** IRQ RFIES2 *****/
111 * RFIES2 based on the GDO2 on the CC1101 module
112 * This is the input on the asynchron mode
113 *****/
114 #define CC430_GDO2_DIR_IN (CC430_GDO2_PxDIR &= ~CC430_GDO2_PIN)
115 #define CC430_GDO2_IN ((CC430_GDO2_PxIN & CC430_GDO2_PIN) >> CC430_GDO2_POS)
116 #define CC430_GDO2_DIR_OUT (CC430_GDO2_PxDIR |= CC430_GDO2_PIN)
117 #define CC430_GDO2_IRQ_RISING_EDGE (RF1AIES &= ~RFIES2) // Positive edge
118 #define CC430_GDO2_IRQ_FALLING_EDGE (RF1AIES |= RFIES2) // Negative edge
119 #define CC430_GDO2_IRQ_ENABLE (RF1AIE |= RFIE2)
120 #define CC430_GDO2_IRQ_DISABLE (RF1AIE &= ~RFIE2)
121 #define CC430_GDO2_IRQ_PENDING ((RF1AIFG & RFIFG2) == RFIFG2)
122 #define CC430_GDO2_IRQ_CLEAR (RF1AIFG &= ~(RFIFG2))
123 /** IRQ RFIFG9 *****/
124 * Positive edge: Sync word sent or received.
125 * Sync word detected
126 *****/
127 #define CC430_SYNC_DETECT_IRQ_MODE (RF1AIES &= ~RFIES9) // Positive edge
128 #define CC430_SYNC_DETECT_IRQ_ENABLE (RF1AIE |= RFIE9)
129 #define CC430_SYNC_DETECT_IRQ_DISABLE (RF1AIE &= ~RFIE9)
130 #define CC430_SYNC_DETECT_IRQ_PENDING ((RF1AIFG & RFIFG9) == RFIFG9)
131 #define CC430_SYNC_DETECT_CLEAR_IRQ (RF1AIFG &= ~(RFIFG9))
132 /** IRQ RFIFG9 *****/
133 * Negative edge: End of packet or in RX when optional address check
134 * End of Packet
135 *****/
136 #define CC430_END_OF_PKT_IRQ_MODE (RF1AIES |= RFIES9) // Negative edge
137 #define CC430_END_OF_PKT_IRQ_ENABLE (RF1AIE |= RFIE9)
138 #define CC430_END_OF_PKT_IRQ_DISABLE (RF1AIE &= ~RFIE9)
139 #define CC430_END_OF_PKT_IRQ_PENDING ((RF1AIFG & RFIFG9) == RFIFG9)
140 #define CC430_END_OF_PKT_CLEAR_IRQ (RF1AIFG &= ~(RFIFG9))
141 // *****/
142 #define CC430_CRC_OK_IRQ_EDGE (RF1AIES &= ~RFIES10)
143 #define CC430_CRC_OK_IRQ_ENABLE (RF1AIE |= RFIE10)
144 #define CC430_CRC_OK_IRQ_DISABLE (RF1AIE &= ~RFIE10)

```

```

145 #define CC430_CRC_OK_IRQ_PENDING          ((RF1AIFG & RFIFG10) == RFIFG10)
146 #define CC430_CRC_OK_CLEAR_IRQ          (RF1AIFG &= ~(RFIFG10))
147
148 #define GDx_TriState 0x2E
149
150 #define CC430_CRC_EN 0x04
151
152 void cc430_tx(uint8_t, uint8_t *);
153 void cc430_rx(uint8_t);
154 void tx_carrier(void);
155 void cc430_set_tx(uint8_t);
156 void cc430_set_rx(uint8_t);
157 void cc430_init_rx(void);
158 void cc430_init_tx(void);
159 void cc430_init_burst(void);
160 void cc430_reset(void);
161 void cc430_config_no_packet(void);
162 void cc430_config_no_packet_rx(void);
163 void cc430_config_no_packet_tx(void);
164 void cc430_config_cali_burst(void);
165 void cc430_config_packet(uint8_t brate);
166 void cc430_fill_tx_fifo(uint8_t * buffer, uint8_t length);
167 void cc430_read_rx_fifo(uint8_t * buffer, uint8_t length);
168 void cc430_enable_crc(void);
169 void cc430_disable_crc(void);
170 void cc430_clear_tx_fifo(void);
171 void cc430_clear_rx_fifo(void);
172 uint8_t cc430_get_rxbytes(void);
173 void cc430_sleep(void);
174 void cc430_idle(void);
175 void cc430_tx_carrier(void);
176 void cc430_tx_start(uint8_t);
177 void cc430_rx_start(uint8_t);
178 void cc430_burst_rx(void);
179 void cc430_burst_tx(void);
180 uint8_t cc430_get_partnum(void);
181 uint8_t cc430_get_version(void);
182 uint8_t cc430_get_marstate(void);
183
184 void cc430_config_cali(void);
185
186 #endif /* cc430_H_ */

1
/*****
2 ** File name      : clk.h
3 ** Hardware       : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4 ** Date           : 24/04/2013
5 ** Last Update    : 03/08/2015
6 ** Author         : Nico Sassano
7 ** Description    : Header for clk
8 *****/
9 #include "main.h"
10
11 #ifndef CLK_H_
12 #define CLK_H_
13
14 #define DCO_MP_1MHZ 29
15 #define DCO_MP_8MHZ 242
16 #define DCO_MP_12MHZ 365
17 #define DCO_MP_16MHZ 487
18
19 void clk_init_startup(void);
20 void clk_init_MHz(uint8_t mhz);
21
22 #endif /* CLK_H_ */

1
/*****
2 ** File name      : delay.h
3 ** Hardware       : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4 ** Date           : 09/04/2013
5 ** Last Update    : 03/08/2015
6 ** Author         : Nico Sassano
7 ** Description    : Header for delay
8 *****/
9 #ifndef DELAY_H_
10 #define DELAY_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 #define DELAY_CYCLES_PER_MS          259
15 #define DELAY_CYCLES_PER_100US_1MHZ  22
16 #define DELAY_CYCLES_PER_10US_16MHZ   36
17
18 void delay_10us_16MHz(uint16_t);
19

```

```

20 #endif /* DELAY_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : i2c.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 09/04/2013
5  **   Last Update     : 03/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Header for I2C Interface
8  *****/
9  #ifndef I2C_H_
10 #define I2C_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 /*****
15 *   Defines
16 *****/
17 #define I2C_SDA_PxSEL  (P1SEL)
18 #define I2C_SDA_PIN    (BIT3)
19 #define I2C_SCL_PxSEL  (P1SEL)
20 #define I2C_SCL_PIN    (BIT2)
21
22 #define UCB0TXIFG      UCTXIFG
23 #define UCB0RXIFG      UCRXIFG
24 #define UCB0I2CIE      UCBOIE
25 #define IFG2           UCB0IFG
26
27 /*****
28 *   Prototyping declaration
29 *****/
30 unsigned char *PTxData;           // Pointer to TX data
31 unsigned char TXByteCtr;
32
33 void i2c_init(void);
34 void i2c_write(uint8_t , uint8_t , uint8_t *);
35 void i2c_read(uint8_t , uint8_t , uint8_t *);
36
37 #endif

1  /*****
2  **   File name       : init.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 05/03/2013
5  **   Last Update     : 03/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Header for init
8  *****/
9  #ifndef INIT_H_
10 #define INIT_H_
11
12 void init(void);
13 void init_for_sleep(void);
14
15 #endif /* INIT_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : led.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 05/03/2013
5  **   Last Update     : 03/08/2015
6  **   Author          : Phillip Durdaut and Nico Sassano
7  **   Description     : Header for LED
8  *****/
9  #ifndef LED_H_
10 #define LED_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 #define LED_RED_PxDIR    (P3DIR)
15 #define LED_RED_PxOUT    (P3OUT)
16 #define LED_RED_PIN      (BIT4)
17 #define LED_YELLOW_PxDIR (P3DIR)
18 #define LED_YELLOW_PxOUT (P3OUT)
19 #define LED_YELLOW_PIN   (BIT3)
20 #define LED_GREEN_PxDIR  (P3DIR)
21 #define LED_GREEN_PxOUT  (P3OUT)
22 #define LED_GREEN_PIN    (BIT2)
23
24 typedef enum {
25     LED_AWAKE = 0,
26     LED_TX,
27     LED_RX,
28     LED_ALL

```

```

29 }LED_t;
30
31 void led_init(void) ;
32 void led_on(LED_t led) ;
33 void led_off(LED_t led) ;
34 void led_toggle(LED_t led) ;
35
36 #endif /* LED_H_ */

1  /*****
2  **   File name       : main.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 06/03/2013
5  **   Last Update     : 03/05/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Header file for the main routine
8  *****/
9  #ifndef MAIN_H_
10 #define MAIN_H_
11
12 #include <cc430f5137.h>
13 #include <signal.h>
14 #include <stdio.h>
15 #include <math.h>
16
17 #include "types.h"
18 #include "adc12.h"
19 #include "adg918.h"
20 #include "as3930.h"
21 #include "balancing.h"
22 #include "cc430.h"
23 #include "delay.h"
24 #include "led.h"
25 #include "i2c.h"
26 #include "temp_sensor.h"
27 #include "timer.h"
28 #include "clk.h"
29 #include "init.h"
30 #include "RF1A.h"
31 #include "hal_pmm.h"
32 #include "spi.h"
33 #include "AD7691.h"
34 #include "AD5270.h"
35
36 /*-----
37    Fix error in msp430x23x.h
38    -----*/
39
40 // #define __MSP430_HAS_ADC12__
41 // #include <msp430/adc12.h>
42
43 /*-----
44    Defines
45    -----*/
46 #define ENABLE_LEDS
47
48 /*****
49 * Port defines
50 *****/
51 // Erweiterungsplatine
52 #define TPS61201_PxDIR (P2DIR)
53 #define TPS61201_PxOUT (P2OUT)
54 #define TPS61201_PIN (BIT0)
55
56 // #define TPS61201_PxDIR (P3DIR)
57 // #define TPS61201_PxOUT (P3OUT)
58 // #define TPS61201_PIN (BIT1)
59
60 #define TPS61201_INIT TPS61201_PxDIR != TPS61201_PIN ;
61 #define TPS61201_ENABLE TPS61201_PxOUT != TPS61201_PIN
62 #define TPS61201_DISABLE TPS61201_PxOUT &=~TPS61201_PIN
63
64
65
66 // Testport deklaration für v0.5
67 #define TEST_PORT_PxDIR (P2DIR)
68 #define TEST_PORT_PxOUT (P2OUT)
69 #define TEST_PORT_PxSEL (P2SEL)
70 #define TEST_PORT_PIN (BIT0)
71
72 #define TEST_PORT_SET_OUTPUT TEST_PORT_PxDIR != TEST_PORT_PxOUT;
73
74 // #define TEST_PIN_ON TEST_PORT_PxOUT != TEST_PORT_PIN
75 // #define TEST_PIN_OFF TEST_PORT_PxOUT &=~TEST_PORT_PIN
76

```

```

77
78 #define ON 0x01
79 #define OFF 0x00
80
81 // #define ENABLE_LEDS
82
83 #define DOWNLINK_DATA_BYTES 4//6 // Incl. address byte
84 #define UPLINK_DATA_BYTES 7//11 // Incl. address byte
85
86 // Frequency offset added to the base frequency (in units of 1.59 kHz – 1.65 kHz)
87 #define FREQUENCY_OFFSET 0
88
89 // Address definitions
90 #define BROADCAST 0x00
91 #define ADDRESS_BASE_STATION 0xFF
92 #define ADDRESS_THIS_SENSOR 0x02
93
94 /*** Downlink commands *****/
95 #define COMMAND_WAKEUP 0x00
96 #define COMMAND_WAKEUP_DONE 0x01
97 #define COMMAND_DOWNLINK_IS_AWAKE 0x02
98 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE 0x03
99 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE 0x04
100 #define COMMAND_DOWNLINK_SLEEP 0x05
101 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE 0x06
102 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE 0x07
103 #define COMMAND_DOWNLINK_BALANCING_ON 0x08
104 #define COMMAND_DOWNLINK_BALANCING_OFF 0x09
105 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE 0x0A
106 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE_TEMPERATURE 0x0B
107 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_MODE 0x0C
108 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RX 0x0D
109 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_DATA_RX 0x0E
110 #define COMMAND_DOWNLINK_BURST_CHECK 0x0F
111 #define COMMAND_DOWNLINK_CONFIG_SET 0x10
112 #define COMMAND_DOWNLINK_CONFIG 0x11
113 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_TMP102 0x12
114 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102 0x13
115 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_TMP102_CALI 0x14
116 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_TMP102_CALI 0x15
117 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_MSP430 0x16
118 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430 0x17
119 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_TEMPERATURE_MSP430_CALI 0x18
120 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_TEMPERATURE_MSP430_CALI 0x19
121 #define COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_TMP102 0x1A
122 #define COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_MSP430 0x1B
123 #define COMMAND_DOWNLINK_CALIBRATION_ADC 0x1C
124 #define COMMAND_DOWNLINK_SEND_VOLTAGE_TEMPERATURE_ALL 0x1D
125 #define COMMAND_DOWNLINK_SAMPLE_VOLTAGE_TEMPERATURE_ALL 0x1E
126 #define COMMAND_CALL_BURST 0x1F
127 #define COMMAND_CLK_OK 0x21
128 #define COMMAND_CLK_UP 0x20
129 #define COMMAND_CLK_DOWN 0x22
130 #define COMMAND_CALL_CLK 0x23
131 #define COMMAND_SW 0x24
132 #define COMMAND_GOERTZEL 0x25
133 #define COMMAND_AD5270_1 0x26
134 #define COMMAND_AD5270_2 0x27
135 #define COMMAND_SET_PREPROCESSING 0x28
136 #define COMMAND_GOERTZEL_FREQ 0x29
137 #define COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ 0x2A
138 #define COMMAND_GOERTZEL_STIMULI_FREQ2 0x2B
139 #define COMMAND_GOERTZEL_NUMB_PERI 0x2C
140
141
142 #define COMMAND_BACK_FROM_BURST 0xFD
143 #define COMMAND_WAIT 0xFE
144 /*** TEST DOWNLINKS *****/
145 #define COMMAND_DOWNLINK_ERROR_TEST 0x99
146
147 #define COMMAND_DOWNLINK_UNKOWN 0xFF
148
149 #define HEADER_LENGTH 0x04
150
151 /*****
152 ** Frequenzen für die Burstmessung
153 *****/
154 #define BURST_FREQ_10000HZ 0x34
155 #define BURST_FREQ_95000HZ 0x33
156 #define BURST_FREQ_90000HZ 0x32
157 #define BURST_FREQ_85000HZ 0x31
158 #define BURST_FREQ_80000HZ 0x30
159 #define BURST_FREQ_75000HZ 0x2F
160 #define BURST_FREQ_70000HZ 0x2E
161 #define BURST_FREQ_65000HZ 0x2D

```

```
162 #define BURST_FREQ_6000HZ 0x2C
163 #define BURST_FREQ_5500HZ 0x2B
164 #define BURST_FREQ_5000HZ 0x2A
165 #define BURST_FREQ_45000HZ 0x29
166 #define BURST_FREQ_40000HZ 0x28
167 #define BURST_FREQ_38000HZ 0x27
168 #define BURST_FREQ_36000HZ 0x26
169 #define BURST_FREQ_34000HZ 0x25
170 #define BURST_FREQ_32000HZ 0x24
171 #define BURST_FREQ_30000HZ 0x23
172 #define BURST_FREQ_28000HZ 0x22
173 #define BURST_FREQ_26000HZ 0x21
174 #define BURST_FREQ_24000HZ 0x20
175 #define BURST_FREQ_22000HZ 0x1F
176 #define BURST_FREQ_20000HZ 0x1E
177 #define BURST_FREQ_18000HZ 0x1C
178 #define BURST_FREQ_16000HZ 0x1B
179 #define BURST_FREQ_14000HZ 0x1A
180 #define BURST_FREQ_12000HZ 0x19
181 #define BURST_FREQ_10000HZ 0x18
182 #define BURST_FREQ_8000HZ 0x17
183 #define BURST_FREQ_6000HZ 0x16
184 #define BURST_FREQ_4000HZ 0x15
185 #define BURST_FREQ_2000HZ 0x14
186 #define BURST_FREQ_1000HZ 0x13
187 #define BURST_FREQ_950HZ 0x12
188 #define BURST_FREQ_900HZ 0x11
189 #define BURST_FREQ_850HZ 0x10
190 #define BURST_FREQ_800HZ 0x0F
191 #define BURST_FREQ_750HZ 0x0E
192 #define BURST_FREQ_700HZ 0x0D
193 #define BURST_FREQ_650HZ 0x0C
194 #define BURST_FREQ_600HZ 0x0B
195 #define BURST_FREQ_550HZ 0x0A
196 #define BURST_FREQ_500HZ 0x09
197 #define BURST_FREQ_450HZ 0x08
198 #define BURST_FREQ_400HZ 0x07
199 #define BURST_FREQ_350HZ 0x06
200 #define BURST_FREQ_300HZ 0x05
201 #define BURST_FREQ_250HZ 0x04
202 #define BURST_FREQ_200HZ 0x03
203 #define BURST_FREQ_150HZ 0x02
204 #define BURST_FREQ_100HZ 0x01
205 #define BURST_FREQ_50HZ 0x00
206
207 #define BURST_VALUES 1800
208 #define BURST_VALUES_50 0x01
209 #define BURST_VALUES_100 0x02
210 #define BURST_VALUES_150 0x03
211 #define BURST_VALUES_200 0x04
212 #define BURST_VALUES_250 0x05
213 #define BURST_VALUES_300 0x06
214 #define BURST_VALUES_350 0x07
215 #define BURST_VALUES_400 0x08
216 #define BURST_VALUES_450 0x09
217 #define BURST_VALUES_500 0x0A
218 #define BURST_VALUES_550 0x0B
219 #define BURST_VALUES_600 0x0C
220 #define BURST_VALUES_650 0x0D
221 #define BURST_VALUES_700 0x0E
222 #define BURST_VALUES_750 0x0F
223 #define BURST_VALUES_800 0x10
224 #define BURST_VALUES_850 0x11
225 #define BURST_VALUES_900 0x12
226 #define BURST_VALUES_1000 0x13
227 #define BURST_VALUES_1500 0x14
228 #define BURST_VALUES_1900 0x15
229 #define BURST_VALUES_2000 0x16
230 #define BURST_VALUES_2500 0x17
231
232 #define BURST_SIGNAL_FREQ_01 0x01
233 #define BURST_SIGNAL_FREQ_05 0x02
234 #define BURST_SIGNAL_FREQ_1 0x03
235 #define BURST_SIGNAL_FREQ_5 0x04
236 #define BURST_SIGNAL_FREQ_10 0x05
237 #define BURST_SIGNAL_FREQ_20 0x06
238 #define BURST_SIGNAL_FREQ_30 0x07
239 #define BURST_SIGNAL_FREQ_40 0x08
240 #define BURST_SIGNAL_FREQ_50 0x09
241 #define BURST_SIGNAL_FREQ_60 0x0A
242 #define BURST_SIGNAL_FREQ_70 0x0B
243 #define BURST_SIGNAL_FREQ_80 0x0C
244 #define BURST_SIGNAL_FREQ_90 0x0D
245 #define BURST_SIGNAL_FREQ_100 0x0E
246 #define BURST_SIGNAL_FREQ_200 0x0F
```

```

247 #define BURST_SIGNAL_FREQ_300          0x10
248 #define BURST_SIGNAL_FREQ_400          0x11
249 #define BURST_SIGNAL_FREQ_500          0x12
250 #define BURST_SIGNAL_FREQ_600          0x13
251 #define BURST_SIGNAL_FREQ_700          0x14
252 #define BURST_SIGNAL_FREQ_800          0x15
253 #define BURST_SIGNAL_FREQ_900          0x16
254 #define BURST_SIGNAL_FREQ_1000         0x17
255
256
257
258 /*****
259 ** Interrupt Modes
260 *****/
261 #define TX_MODE                          0x00
262 #define RX_MODE                          0x01
263 #define BURST_MODE                       0x02
264 #define BURST_CALL_MODE                  0x03
265
266 #define ALERT_HIGH                       0x00
267 #define ALERT_LOW                        0x01
268
269 #define TEMP_NORMAL                      0x00
270 #define TEMP_HIGH                       0x01
271
272 /*****
273 ** TIMER Macros
274 *****/
275 #define TIMERA_BALANCING                  0x01
276 #define TIMERA_DELAY                     0x02
277
278 #define TIMERB_BURST                     0x01
279 #define TIMERB_BURST_END                 0x02
280 #define TIMERB_DELAY                     0x03
281 #define TIMERB_CLOCK_CALI                0x04
282
283 // Clock frequencies
284 #define DCOCLK                            1000000 // DCO Clock frequency
285 #define MCLK                              1000000 // Main System Clock frequency
286 #define SMCLK                             1000000 // Sub System Clock frequency
287
288 /*****
289 ** IRQ Macros
290 *****/
291 #define IRQ_SET_RX                        (irq_mode = RX_MODE)
292 #define IRQ_IS_RX                         (irq_mode == RX_MODE)
293 #define IRQ_SET_TX                        (irq_mode = TX_MODE)
294 #define IRQ_IS_TX                         (irq_mode == TX_MODE)
295 #define IRQ_SET_BURST                     (irq_mode = BURST_MODE)
296 #define IRQ_IS_BURST                      (irq_mode == BURST_MODE)
297 #define IRQ_SET_CALL_BURST                (irq_mode = BURST_CALL_MODE)
298 #define IRQ_IS_CALL_BURST                 (irq_mode == BURST_CALL_MODE)
299
300 /*****
301 ** IRQ_ALERT_SET_HIGH bei zu hoher Temperatur
302 ** IRQ_ALERT_IS_LOW bei normaler Temperatur
303 *****/
304 #define IRQ_ALERT_SET_HIGH                (irq_alert = ALERT_HIGH)
305 #define IRQ_ALERT_IS_HIGH                 (irq_alert == ALERT_HIGH)
306 #define IRQ_ALERT_SET_LOW                 (irq_alert = ALERT_LOW)
307 #define IRQ_ALERT_IS_LOW                  (irq_alert == ALERT_LOW)
308
309 #define TEMP_IS_NORMAL                    (temp_state == TEMP_NORMAL)
310 #define TEMP_SET_NORMAL                    (temp_state = TEMP_NORMAL)
311 #define TEMP_IS_HIGH                      (temp_state == TEMP_HIGH)
312 #define TEMP_SET_HIGH                      (temp_state = TEMP_HIGH)
313
314 /*****
315 ** IRQ TIMER
316 *****/
317 #define IRQ_TIMER_SET_BALANCING            (irq_timera = TIMERA_BALANCING)
318 #define IRQ_TIMER_UNSET_BALANCING          (irq_timera = 0x00)
319 #define IRQ_TIMER_IS_BALANCING             (irq_timera == TIMERA_BALANCING)
320 #define IRQ_TIMER_IS_DELAY                 (irq_timera == TIMERA_DELAY)
321
322 #define IRQ_TIMERB_SET_CLOCK_CALI          (irq_timerb = TIMERB_CLOCK_CALI)
323 #define IRQ_TIMERB_UNSET_CLOCK_CALI        (irq_timerb = 0x00)
324 #define IRQ_TIMERB_IS_CLOCK_CALI           (irq_timerb == TIMERB_CLOCK_CALI)
325
326 #define IRQ_TIMERB_SET_BURST               (irq_timerb = TIMERB_BURST)
327 #define IRQ_TIMERB_UNSET_BURST             (irq_timerb = 0x00)
328 #define IRQ_TIMERB_IS_BURST                (irq_timerb == TIMERB_BURST)
329
330 #define IRQ_TIMERB_SET_DELAY               (irq_timerb = TIMERB_DELAY)
331 #define IRQ_TIMERB_UNSET_DELAY             (irq_timerb = 0x00)

```

```

332 #define IRQ_TIMERB_IS_DELAY      (irq_timerb == TIMERB_DELAY)
333
334 /*****
335 ** Burst Flag Macros
336 *****/
337 #define BURST_ERROR_FLAG_SET      (burst_error_flag = 0x01)
338 #define BURST_ERROR_FLAG_UNSET    (burst_error_flag = 0x00)
339 #define BURST_ERROR_FLAG_IS_SET   (burst_error_flag == 0x01)
340 #define BURST_ERROR_FLAG_IS_UNSET (burst_error_flag == 0x00)
341
342 #define BURST_CALI_FLAG_SET       (burst_cali_flag = 0x01)
343 #define BURST_CALI_FLAG_UNSET     (burst_cali_flag = 0x00)
344 #define BURST_CALI_FLAG_IS_SET    (burst_cali_flag == 0x01)
345 #define BURST_CALI_FLAG_IS_UNSET  (burst_cali_flag == 0x00)
346
347 /*****
348 ** ADC AUSWAHL
349 *****/
350 #define ADC12_INT_SELECT          0x00
351 #define AD7691_EXT_SELECT         0x01
352
353 #define ADC12_INT_IS_SELECT       adc_mode == ADC12_INT_SELECT
354 #define AD7691_EXT_IS_SELECT      adc_mode == AD7691_EXT_SELECT
355
356 /*-----
357  Types
358 -----*/
359
360 typedef enum { S_INIT ,
361               S_SLEEP ,
362               S_RX ,
363               S_WAKEUP ,
364               S_WAKEUP_RX ,
365               S_WAKEUP_DONE ,
366               S_TX_AWAKE ,
367               S_SAMPLE ,
368               S_TX_SAMPLE ,
369               S_BALANC_FIRST_START ,
370               S_BALANC_ON ,
371               S_BALANC_OFF
372             } state_t ;
373
374
375 // uint16_t temp_high = 0x01A0; //0x01A0 -> 26°C
376 // uint16_t temp_low = 0x0190; // 0x0190 -> 25°C
377
378 /*-----
379  Macros
380 -----*/
381
382 #define ENTER_LPM4                __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);
383 #define EXIT_LPM4                 __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);
384
385
386
387 #endif /* MAIN_H_ */

```

```

1 /*****
2 ** File name      : spi.h
3 ** Hardware      : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4 ** Date          : 21/12/2014
5 ** Last Update   : 03/08/2015
6 ** Author        : Nico Sassano
7 ** Description   : Header file for the spi routine
8 *****/
9 #ifndef SPI_H_
10 #define SPI_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 #define LTC2376          0x00
15 #define AS3930           0x01
16
17 // Defines for the LTC2376 ADC
18 #define SPI_LTC2376_CS_PxDIR    P5DIR
19 #define SPI_LTC2376_CS_PxOUT    P5OUT
20 #define SPI_LTC2376_CS_PIN      BIT0
21
22 #define SPI_PxSEL             P1SEL
23 #define SPI_PxDIR             P1DIR
24 #define SPI_PxIN              P1IN
25 #define SPI_MOSI_PIN          BIT6
26 #define SPI_MISO_PIN          BIT5
27 #define SPI_CLK_PIN           BIT7
28

```



```

29 #define SPL_LTC2376_CS_ENABLE          SPL_LTC2376_CS_PxOUT &= ~SPL_LTC2376_CS_PIN
30 #define SPL_LTC2376_CS_DISABLE        SPL_LTC2376_CS_PxOUT |= SPL_LTC2376_CS_PIN
31
32 // Defines for the AS3930
33 #define SPL_AS3930_CS_PxDIR            P5DIR
34 #define SPL_AS3930_CS_PxOUT           P5OUT
35 #define SPL_AS3930_CS_PIN              BIT0
36
37 #define SPL_PxSEL                       P1SEL
38 #define SPL_PxDIR                       P1DIR
39 #define SPL_PxOUT                       P1OUT
40 #define SPL_PxIN                        P1IN
41 #define SPL_MOSI_PIN                    BIT6
42 #define SPL_MISO_PIN                    BIT5
43 #define SPL_CLK_PIN                     BIT7
44
45 #define SPL_AS3930_CS_ENABLE            SPL_AS3930_CS_PxOUT &= ~SPL_AS3930_CS_PIN
46 #define SPL_AS3930_CS_DISABLE          SPL_AS3930_CS_PxOUT |= SPL_AS3930_CS_PIN
47
48 void init_spi(void);
49 void spi_write_register(uint8_t, uint8_t, uint8_t);
50 char spi_read_register(uint8_t, uint8_t);
51 void spi_send_command(uint8_t, uint8_t);
52
53 #endif /* SPI_H */

```

```

1  /*****
2  **   File name       : temp_sensor.h
3  **   Hardware        : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  **   Date            : 07/03/2013
5  **   Last Update     : 03/08/2015
6  **   Author          : Nico Sassano
7  **   Description     : Header file for the Temperatur Sensor routine
8  *****/
9  #ifndef TEMP_SENSOR_H_
10 #define TEMP_SENSOR_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 /**** Address of the Temp. Sensor *****/
15 #define ADDR_TMP102          0x48
16
17 #define TMP102_ALERT_PxREN    PIREN
18 #define TMP102_ALERT_PxOUT    P1OUT
19 #define TMP102_ALERT_PxDIR    P1DIR
20 #define TMP102_ALERT_PxIES    P1IES
21 #define TMP102_ALERT_PxIE     P1IE
22 #define TMP102_ALERT_PxIFG    P1IFG
23 #define TMP102_ALERT_PIN      BIT1
24
25 #define TMP102_ALERT_REN_EN    (TMP102_ALERT_PxREN |= TMP102_ALERT_PIN)
26 #define TMP102_ALERT_SET_PULLUP (TMP102_ALERT_PxOUT |= TMP102_ALERT_PIN)
27 #define TMP102_ALERT_SET_PULLDOWN (TMP102_ALERT_PxOUT &= ~TMP102_ALERT_PIN)
28 #define TMP102_ALERT_DIR_IN    (TMP102_ALERT_PxDIR &= ~TMP102_ALERT_PIN)
29 #define TMP102_ALERT_IRQ_RISING_EDGE (TMP102_ALERT_PxIES &= ~TMP102_ALERT_PIN)
30 #define TMP102_ALERT_IRQ_FALLING_EDGE (TMP102_ALERT_PxIES |= TMP102_ALERT_PIN)
31 #define TMP102_ALERT_IRQ_ENABLE (TMP102_ALERT_PxIE |= TMP102_ALERT_PIN)
32 #define TMP102_ALERT_IRQ_DISABLE (TMP102_ALERT_PxIE &= ~TMP102_ALERT_PIN)
33 #define TMP102_ALERT_IRQ_PENDING ((TMP102_ALERT_PxIFG & TMP102_ALERT_PIN) == TMP102_ALERT_PIN)
34 #define TMP102_ALERT_CLEAR_IRQ (TMP102_ALERT_PxIFG &= ~(TMP102_ALERT_PIN))
35
36 #define TMP102_SET_IRQ_RISING_EDGE (TMP102_ALERT_DIR_IN); \
37 (TMP102_ALERT_REN_EN); \
38 (TMP102_ALERT_SET_PULLUP); \
39 (TMP102_ALERT_IRQ_RISING_EDGE); \
40
41 #define TMP102_SET_IRQ_FALLING_EDGE (TMP102_ALERT_DIR_IN); \
42 (TMP102_ALERT_REN_EN); \
43 (TMP102_ALERT_SET_PULLUP); \
44 (TMP102_ALERT_IRQ_FALLING_EDGE); \
45
46
47 /**** Register addresses *****/
48 #define TMP102_REG_TEMP          0x00 // Temperatur
49 #define TMP102_REG_CONF          0x01 // Configuration
50 #define TMP102_REG_HIGH          0x02 // Temperatur Low
51 #define TMP102_REG_LOW           0x03 // Temperatur High
52
53 #define TMP102_REG_OS             0x8000
54 #define TMP102_REG_R1            0x4000
55 #define TMP102_REG_R0            0x2000
56 #define TMP102_REG_F1            0x1000
57 #define TMP102_REG_F0            0x0800
58 #define TMP102_REG_POL           0x0400
59 #define TMP102_REG_TM            0x0200

```

```

60 #define TMP102_REG_SD          0x0100
61
62 #define TMP102_REG_CR1        0x0080
63 #define TMP102_REG_CR0        0x0040
64 #define TMP102_REG_AL         0x0020
65 #define TMP102_REG_EM         0x0010
66
67 #define TMP102_EM_OFF          (config_value &=~TMP102_REG_EM)
68 #define TMP102_EM_ON           (config_value |= TMP102_REG_EM)
69 #define TMP102_SD_OFF          (config_value &=~TMP102_REG_SD)
70 #define TMP102_SD_ON           (config_value |= TMP102_REG_SD)
71 #define TMP102_COMPERATOR_MODE (config_value &=~TMP102_REG_TM)
72 #define TMP102_INTERRUPT_MODE (config_value |= TMP102_REG_TM)
73 #define TMP102_POL_INV         (config_value &=~TMP102_REG_POL)
74 #define TMP102_POL_NORM        (config_value |= TMP102_REG_POL)
75
76 #define TMP102_FAULTS_1        (config_value &= ~(TMP102_REG_F1)); \
77                               (config_value &= ~(TMP102_REG_F0)); \
78 #define TMP102_FAULTS_2        (config_value &= ~(TMP102_REG_F1)); \
79                               (config_value |= (TMP102_REG_F0)); \
80 #define TMP102_FAULTS_4        (config_value |= (TMP102_REG_F1)); \
81                               (config_value &= ~(TMP102_REG_F0)); \
82 #define TMP102_FAULTS_6        (config_value |= (TMP102_REG_F1)); \
83                               (config_value |= (TMP102_REG_F0)); \
84
85 #define TMP102_CON_RATE_1      (config_value &= ~(TMP102_REG_CR1)); \
86                               (config_value &= ~(TMP102_REG_CR0)); \
87 #define TMP102_CON_RATE_2      (config_value &= ~(TMP102_REG_CR1)); \
88                               (config_value |= (TMP102_REG_CR0)); \
89 #define TMP102_CON_RATE_4      (config_value |= (TMP102_REG_CR1)); \
90                               (config_value &= ~(TMP102_REG_CR0)); \
91 #define TMP102_CON_RATE_6      (config_value |= (TMP102_REG_CR1)); \
92                               (config_value |= (TMP102_REG_CR0)); \
93
94 /**** Prototyp declaration *****/
95 void temp_sensor_init(void);
96 void temp_sensor_get_contr_reg(void);
97 uint16_t temp_sensor_get_temp(void);
98 void temp_sensor_config_reg(void);
99 void temp_sensor_set_alert(uint16_t, uint16_t);
100
101 #endif /* TEMP_SENSOR_H */

```

```

1  /*****
2  ** File name      : imer.h
3  ** Hardware       : BATSEN ZS Klasse 3 v0.5
4  ** Date          : 13/03/2013
5  ** Last Update   : 03/08/2015
6  ** Author        : Nico Sassano
7  ** Description   : Header file for the timer routine
8  *****/
9  #ifndef TIMER_H_
10 #define TIMER_H_
11
12 #include "main.h"
13
14 /*****
15 ** Bending Defines for CC430 use EM 31.07.2014
16 *****/
17 #define TACCR0 TA0CCR0
18 #define TACCR1 TA0CCR1
19 #define TACCTL0 TA0CCTL0
20 #define TACCTL1 TA0CCTL1
21 #define TACTL TA0CTL
22 #define TAR TA0R
23 #define TAEX0 TA0EX0
24
25 #define TBCCR0 TA1CCR0
26 #define TBCCR1 TA1CCR1
27 #define TBCCTL0 TA1CCTL0
28 #define TBCCTL1 TA1CCTL1
29 #define TBCLR TA1CLR
30 #define TBCTL TA1CTL
31 #define TBSSEL_2 TASSEL_2
32
33 /*****
34 ** Defines Timer A
35 *****/
36 #define TIMER_A_START_UP_MODE (TACTL |= MC0)
37 #define TIMER_A_START_CM_MODE (TACTL |= MC1)
38 #define TIMER_A_START_UD_MODE (TACTL |= (MC1 | MC0))
39
40 #define TIMER_A_STOP (TACTL &= ~(MC0 | MC1))
41
42 #define TIMER_A_RESET (TACTL = TA1CLR)

```



```
128 #define TIMER_B_0_CM_IRQ_ENABLE      (TBCCTL0 != CCIE);
129 #define TIMER_B_1_CM_IRQ_ENABLE      (TBCCTL1 != CCIE);
130 #define TIMER_B_2_CM_IRQ_ENABLE      (TBCCTL2 != CCIE);
131
132 #define TIMER_B_0_CM_IRQ_DISABLE     (TBCCTL0 &= ~CCIE);
133 #define TIMER_B_1_CM_IRQ_DISABLE     (TBCCTL1 &= ~CCIE);
134 #define TIMER_B_2_CM_IRQ_DISABLE     (TBCCTL2 &= ~CCIE);
135
136
137 /**** Prototyp declaration *****/
138 void timer_a_init(void);
139 void timer_a_init_balanc(void);
140 void timer_a_test(void);
141 void timer_b_init_cali(void);
142 void timer_b_init_clock_cali(void);
143 void timer_a_delay_ms(uint16_t);
144 void timer_b_init_burst(uint8_t);
145 void timer_b_init_burst_end(uint8_t);
146 void delay_ms(uint16_t);
147 void timer_a_delay(uint16_t);
148
149 #endif

1 /*-----*/
2 Description: MSP430 (mspcc) data types.
3 Date: 12/02/2012
4 Last Update: 12/02/2012
5 Author: Phillip Durdaut
6 /*-----*/
7
8 #ifndef TYPES_H_
9 #define TYPES_H_
10
11 /*-----*/
12 Types
13 /*-----*/
14
15 typedef unsigned char      uint8_t;
16 typedef signed char       sint8_t;
17 typedef unsigned int       uint16_t;
18 typedef signed int        sint16_t;
19 typedef unsigned long      uint32_t;
20 typedef signed long       sint32_t;
21 typedef unsigned long long uint64_t;
22 typedef signed long long  sint64_t;
23
24 typedef unsigned char      u8_t;
25 typedef signed char       s8_t;
26 typedef unsigned int       u16_t;
27 typedef signed int        s16_t;
28 typedef unsigned long      u32_t;
29 typedef signed long       s32_t;
30 typedef unsigned long long u64_t;
31 typedef signed long long  s64_t;
32 #endif /* TYPES_H_ */
```

# M. Quellcode Matlab Auswertung

```
1 %% Erste EIS Messung mit finalelem Sensor
2 % Delay Zeit auf BS waren SysCtlDelay(3302);
3 % Test mit Sensor 0x02
4 % Stromversorgung über DCDC
5 % Anregung: FuelCon
6 % Zelle: 7
7 %
8 % Rheostat Gleichspannungsabzug : 0x3ff
9 % Rheostat Verstärkung : 0x02f
10
11 clear all
12 close all;
13
14 % Messdaten FuelCon vom 29.05.15
15 daten = [
16 2102.5085 -6.38827 0.139448
17 1473.514 -6.511894 0.343586
18 1032.6919 -6.664385 0.508807
19 723.7479 -6.839265 0.640194
20 507.2287 -7.035753 0.745141
21 355.4842 -7.247742 0.823737
22 249.1362 -7.469934 0.884654
23 174.6037 -7.694266 0.921424
24 122.3686 -7.921372 0.948425
25 85.7603 -8.149984 0.969278
26 60.1039 -8.380949 0.986115
27 42.123 -8.618113 0.99769
28 29.5213 -8.859452 0.997143
29 20.6896 -9.102606 0.982995
30 14.5 -9.337853 0.95234
31 10.1621 -9.535304 0.914475
32 7.122 -9.752221 0.868444
33 4.9914 -9.930971 0.830639
34 3.4981 -10.088704 0.810213
35 2.4516 -10.239494 0.810948
36 1.7182 -10.39311 0.833895
37 1.2042 -10.558719 0.884799
38 0.8439 -10.724551 0.967921
39 0.5914 -11.024745 1.0419
40 0.4145 -11.240341 1.169454
41 0.2905 -11.485869 1.345238
42 0.2036 -11.778277 1.555528
43 0.1427 -12.121537 1.82476
44 0.1 -12.511893 2.163643
45 ];
46
47 %%
48 mess = 0;
49 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
50 %% 50Hz Burst , 0.1Hz Signal , 2000Samples
51 mess = mess + 1;
52 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 0.1));
53
54 % Messwerte Rohdaten
55 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
56 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
57
58 % Berechnung der Stromwerte
59 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65)*(10));
60
61 %Berechnung der Spannungswerte
62 gain = (1+((47*(100000/1024))/ 1000));
63 v = ((v.*(adc_value))/gain);
64
65 Fs = 50; % Burstfrequenz
66 f = 0.1; % Anregefrequenz
67 m = 1; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
68 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
69 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
70
```

```

71 c = c - min(c(1:N));
72 v = v - min(v(1:N));
73
74 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
75 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
76 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
77 Z_Z_2905(mess) = U/I;
78 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
79 %% 100Hz Burst, 0.5Hz Signal, 2000Samples
80 mess = mess + 1;
81 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 0.5));
82
83 % Messwerte Rohdaten
84 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
85 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
86
87 % Berechnung der Stromwerte
88 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
89
90 %Berechnung der Spannungswerte
91 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
92 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
93
94 Fs = 100; % Burstfrequenz
95 f = 0.5; % Anregefrequenz
96 m = 5; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
97 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
98 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
99
100 c = c - min(c(1:N));
101 v = v - min(v(1:N));
102
103 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
104 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
105 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
106 Z_Z_2905(mess) = U/I;
107 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
108 %% 200Hz Burst, 1Hz Signal
109 mess = mess + 1;
110 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 1));
111
112 % Messwerte Rohdaten
113 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
114 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
115
116 % Berechnung der Stromwerte
117 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
118
119 %Berechnung der Spannungswerte
120 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
121 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
122
123 Fs = 200; % Burstfrequenz
124 f = 1.03; % Anregefrequenz
125 m = 9; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
126 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
127 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
128
129 c = c - min(c(1:N));
130 v = v - min(v(1:N));
131
132 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
133 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
134 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
135 Z_Z_2905(mess) = U/I;
136 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
137 %% 200Hz Burst, 5Hz Signal
138 mess = mess + 1;
139 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 5));
140
141 % Messwerte Rohdaten
142 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
143 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
144
145 % Berechnung der Stromwerte
146 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
147
148 %Berechnung der Spannungswerte
149 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
150 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
151
152 Fs = 200; % Burstfrequenz
153 f = 5; % Anregefrequenz
154 m = 20; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
155 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode

```

```

156 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
157
158 c = c - min(c(1:N));
159 v = v - min(v(1:N));
160
161 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
162 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
163 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
164 Z_Z_2905(mess) = U/I;
165 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
166 %% 1000Hz Burst, 10Hz Signal
167 mess = mess + 1;
168 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 10));
169
170 % Messwerte Rohdaten
171 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
172 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
173
174 % Berechnung der Stromwerte
175 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
176
177 %Berechnung der Spannungswerte
178 gain = (1 + ((50 * (100000/1024)) / 1000));
179 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
180
181 Fs = 1000; % Burstfrequenz
182 f = 10; % Anregefrequenz
183 m = 10; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
184 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
185 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
186
187 c = c - min(c(1:N));
188 v = v - min(v(1:N));
189
190 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
191 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
192 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
193 Z_Z_2905(mess) = U/I;
194 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
195 %% 2000Hz Burst, 50Hz Signal
196 mess = mess + 1;
197 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 50));
198
199 % Messwerte Rohdaten
200 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
201 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
202
203 % Berechnung der Stromwerte
204 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
205
206 %Berechnung der Spannungswerte
207 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
208 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
209
210 Fs = 2000; % Burstfrequenz
211 f = 50; % Anregefrequenz
212 m = 25; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
213 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
214 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
215
216 c = c - min(c(1:N));
217 v = v - min(v(1:N));
218
219 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
220 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
221 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
222 Z_Z_2905(mess) = U/I;
223 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
224 %% 2000Hz Burst, 100Hz Signal
225 mess = mess + 1;
226 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 100));
227
228 % Messwerte Rohdaten
229 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
230 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
231
232 % Berechnung der Stromwerte
233 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
234
235 %Berechnung der Spannungswerte
236 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
237 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
238
239 Fs = 2000; % Burstfrequenz
240 f = 100; % Anregefrequenz

```

```

241 m = 98; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
242 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
243 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
244
245 c = c - min(c(1:N));
246 v = v - min(v(1:N));
247
248 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
249 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
250 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
251 Z_Z_2905(mess) = U/I;
252 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
253 %% 8000Hz Burst, 250Hz Signal
254 mess = mess + 1;
255 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 250));
256
257 % Messwerte Rohdaten
258 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
259 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
260
261 % Berechnung der Stromwerte
262 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
263
264 %Berechnung der Spannungswerte
265 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
266 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
267
268 Fs = 8000; % Burstfrequenz
269 f = 250; % Anregefrequenz
270 m = 16; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
271 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
272 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
273
274 c = c - min(c(1:N));
275 v = v - min(v(1:N));
276
277 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
278 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
279 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
280 Z_Z_2905(mess) = U/I;
281 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
282 %% 8000Hz Burst, 500Hz Signal
283 mess = mess + 1;
284 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 500));
285
286 % Messwerte Rohdaten
287 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
288 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
289
290 % Berechnung der Stromwerte
291 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
292
293 %Berechnung der Spannungswerte
294 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
295 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
296
297 Fs = 8000; % Burstfrequenz
298 f = 500; % Anregefrequenz
299 m = 90; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
300 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
301 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
302
303 c = c - min(c(1:N));
304 v = v - min(v(1:N));
305
306 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
307 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
308 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
309 Z_Z_2905(mess) = U/I;
310 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
311 %% 8000Hz Burst, 750Hz Signal
312 mess = mess + 1;
313 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 750));
314
315 % Messwerte Rohdaten
316 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
317 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
318
319 % Berechnung der Stromwerte
320 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
321
322 %Berechnung der Spannungswerte
323 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
324 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
325

```



```

326 Fs = 8000; % Burstfrequenz
327 f = 750; % Anrefrequenz
328 m = 50; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
329 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
330 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
331
332 c = c - min(c(1:N));
333 v = v - min(v(1:N));
334
335 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
336 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
337 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
338 Z_Z_2905(mess) = U/I;
339 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
340 %% 8000Hz Burst, 1000Hz Signal
341 mess = mess + 1;
342 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 1000));
343
344 % Messwerte Rohdaten
345 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
346 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
347
348 % Berechnung der Stromwerte
349 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
350
351 %Berechnung der Spannungswerte
352 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
353 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
354
355 Fs = 8000; % Burstfrequenz
356 f = 1000; % Anrefrequenz
357 m = 50; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
358 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
359 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
360
361 c = c - min(c(1:N));
362 v = v - min(v(1:N));
363
364 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
365 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
366 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
367 Z_Z_2905(mess) = U/I;
368 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
369 %% 8000Hz Burst, 2000Hz Signal
370 mess = mess + 1;
371 adc_value = (2.42/4095) - (((2.42/4095)/100) * ((8.0/2000) * 2000));
372
373 % Messwerte Rohdaten
374 v = [Daten auf der beiliegenden CD];
375 c = [Daten auf der beiliegenden CD];
376
377 % Berechnung der Stromwerte
378 c = (((c.*(0.00080586)) - 1.65) * (10));
379
380 %Berechnung der Spannungswerte
381 gain = (1 + ((47 * (100000/1024)) / 1000));
382 v = ((v.*(adc_value)) / gain);
383
384 Fs = 8000; % Burstfrequenz
385 f = 2000; % Anrefrequenz
386 m = 5; % Anzahl der Perioden pro Berechnung
387 Np = Fs/f; % Np Anzahl Abtastwerte pro Periode
388 N = m * Np; % Anzahl der Abtastpunkte für die Berechnung
389
390 c = c - min(c(1:N));
391 v = v - min(v(1:N));
392
393 freq_indices = round(f/Fs*N) + 1;
394 I = goertzel(c(1:N),freq_indices);
395 U = goertzel(v(1:N),freq_indices);
396 Z_Z_2905(mess) = U/I;
397 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
398 %% Plot der Daten
399 h = figure(1);
400 plot((real(Z_Z_2905) * 1000), (-imag(Z_Z_2905) * 1000), 'x', -daten(:,2), daten(:,3));
401 xlabel('Realteil in m\Omega');
402 ylabel('Imaginärteil in -m\Omega');
403 grid on;
404 hold on;
405 xlim([5 13]);

```

# N. Verzeichnisstruktur des Datenträgers

Die gedruckten Versionen dieser Masterarbeit ist ein Datenträger beigelegt, der bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Riemschneider an der HAW Hamburg eingesehen werden kann.

Das Hauptverzeichnis des Datenträgers ist wie folgt aufgeteilt:

- **Auswertung der EIS Daten:** Dieser Ordner beinhaltet das Auswerteskript der EIS-Messung mit den dazugehörigen Messwerten.
- **Auswertung Testimpedanz:** Dieser Ordner beinhaltet das Auswerteskript für die Vermessung der Testimpedanz mit den dazugehörigen Messwerten.
- **Goertzel Testprogramm:** Dieser Ordner beinhaltet den Quellcode des PC Goertzel-Testprogramm mit den für die Auswertung benutzten Messwerten.
- **Platinendaten:** Dieser Ordner beinhaltet sämtliche Platinen und Schaltungsunterlagen, die im Laufe dieser Arbeit angefertigt wurden
- **Quellcode Batteriesteuergerät:** Dieser Ordner beinhaltet den Quellcode des Batteriesteuergeräts.
- **Quellcode Zellsensor:** Dieser Ordner beinhaltet den Quellcode des Zellsensors.
- **Thesis Nico Sassano:** Dieser Ordner beinhaltet die vorliegende Arbeit in elektronischer Form.

# Versicherung über die Selbstständigkeit

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen habe ich unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Hamburg, 14. August 2015

Ort, Datum

Unterschrift